

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2018年10月11日(11.10.2018)



(10) 国際公開番号

WO 2018/186194 A1

(51) 国際特許分類:

H01L 27/146 (2006.01) H01L 25/065 (2006.01)
H01L 21/02 (2006.01) H01L 25/07 (2006.01)
H01L 21/3205 (2006.01) H01L 25/18 (2006.01)
H01L 21/768 (2006.01) H04N 5/369 (2011.01)
H01L 23/522 (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2018/011567

(22) 国際出願日: 2018年3月23日(23.03.2018)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:

特願 2017-074810 2017年4月4日(04.04.2017) JP
特願 2017-156733 2017年8月15日(15.08.2017) JP

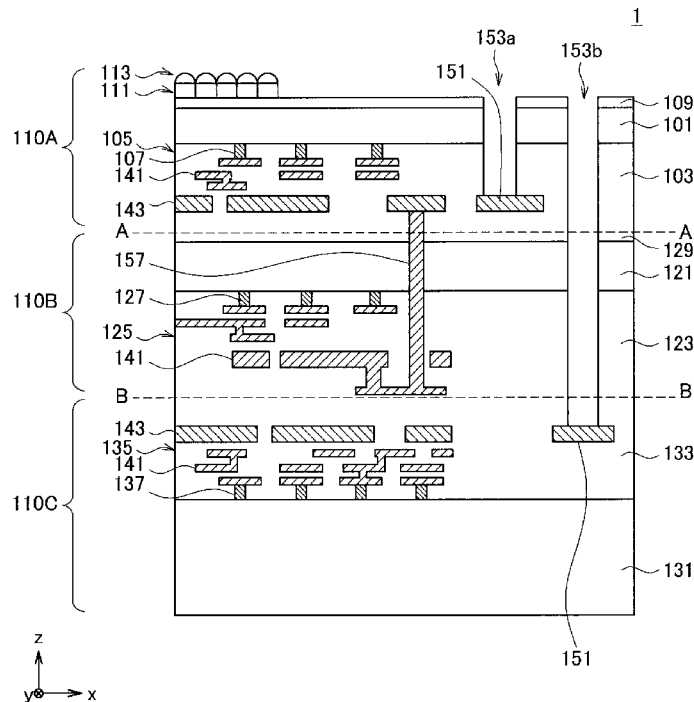
(71) 出願人: ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社(SONY SEMICONDUCTOR SOLUTIONS CORPORATION) [JP/JP]; 〒2430014 神奈川県厚木市旭町四丁目14番1号 Kanagawa (JP).

(72) 発明者: 橋口 日出登(HASHIGUCHI, Hideto); 〒2430014 神奈川県厚木市旭町四丁目14番1号 ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社内 Kanagawa (JP). 庄子 礼二郎(SHOHJI, Reijiroh); 〒2430014 神奈川県厚木市旭町四丁目14番1号 ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社内 Kanagawa (JP). 堀越 浩(HORIKOSHI, Hiroshi); 〒2430014 神奈川県厚木市旭町四丁目14番1号 ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会

(54) Title: SOLID STATE IMAGING DEVICE AND ELECTRONIC APPARATUS

(54) 発明の名称: 固体撮像装置、及び電子機器

[図1]



(57) Abstract: [Problem] To provide a solid state imaging device and an electronic apparatus that have improved performance. [Solution] A solid state imaging device that is formed by laminating, in order, a first substrate, a second substrate, and a third substrate. The first substrate is formed by laminating a first semiconductor substrate and a first multilayer wiring layer and has formed thereon a pixel unit that comprises an array of pixels. The second substrate is formed by laminating a second semiconductor substrate and a second multilayer wiring layer and has formed thereon a circuit that has



社内 Kanagawa (JP). 三橋 生枝(MITSUHASHI, Ikue); 〒2430014 神奈川県厚木市旭町四丁目 1 4 番 1 号 ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社内 Kanagawa (JP). 飯島 匡(IIJIMA, Tadashi); 〒2430014 神奈川県厚木市旭町四丁目 1 4 番 1 号 ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社内 Kanagawa (JP). 亀嶋 隆季(KAMESHIMA, Takatoshi); 〒2430014 神奈川県厚木市旭町四丁目 1 4 番 1 号 ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社内 Kanagawa (JP). 石田 実(ISHIDA, Minoru); 〒2430014 神奈川県厚木市旭町四丁目 1 4 番 1 号 ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社内 Kanagawa (JP). 羽根田 雅希(HANEDA, Masaki); 〒2430014 神奈川県厚木市旭町四丁目 1 4 番 1 号 ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社内 Kanagawa (JP).

(74) 代理人: 亀谷 美明, 外 (KAMEYA, Yoshiaki et al.); 〒1600004 東京都新宿区四谷 3 - 1 - 3 第一富澤ビル はづき国際特許事務所 四谷オフィス Tokyo (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第21条(3))

a prescribed function. The third substrate is formed by laminating a third semiconductor substrate and a third multilayer wiring layer and has formed thereon a circuit that has a prescribed function. The first substrate and the second substrate are adhered to each other such that the first multilayer wiring layer and the second semiconductor substrate face. A first connection structure that is for electrically connecting a circuit on the first substrate and the circuit on the second substrate includes a via that is structured such that a conductive material is embedded or formed as a film in: a first through hole that exposes wiring that is in the first multilayer wiring layer; and a second through hole that is different from the first through hole and exposes wiring that is in the second multilayer wiring layer.

(57) 要約: 【課題】性能がより向上した固体撮像装置及び電子機器を提供する。【解決手段】画素が配列された画素部が形成され、第1半導体基板及び第1多層配線層が積層された第1基板と、所定の機能を有する回路が形成され、第2半導体基板及び第2多層配線層が積層された第2基板と、所定の機能を有する回路が形成され、第3半導体基板及び第3多層配線層が積層された第3基板と、がこの順に積層されて構成され、前記第1基板と前記第2基板とは、前記第1多層配線層と前記第2半導体基板とが対向するように貼り合わされ、前記第1基板の回路と前記第2基板の回路とを電気的に接続するための第1の接続構造は、前記第1多層配線層内の配線を露出させる第1の貫通孔と、前記第2多層配線層内の配線を露出させる前記第1の貫通孔とは異なる第2の貫通孔と、に導電材料が埋め込まれた構造、又は成膜された構造、を有するビア、を含む、固体撮像装置。

明 細 書

発明の名称： 固体撮像装置、及び電子機器

技術分野

[0001] 本開示は、固体撮像装置、及び電子機器に関する。

背景技術

[0002] 固体撮像装置として、画素部が設けられる画素チップと、固体撮像装置の動作に係る各種の信号処理を実行するロジック回路が搭載されるロジックチップ等と、が積層された構造を有するものが開発されている。例えば、特許文献1には、画素チップと、ロジックチップと、画素チップの画素部において取得された画素信号を保持するメモリ回路が搭載されるメモリチップと、が積層された3層積層型の固体撮像装置が開示されている。

[0003] なお、本明細書では、固体撮像装置の構造について説明する際に、画素チップ、ロジックチップ、又はメモリチップが形成される半導体基板と、当該半導体基板上に形成される多層配線層と、を合わせた構成を、「基板」とも呼称する。そして、当該「基板」のことを、積層構造における上側（観察光が入射する側）から下側に向かって、順に、「第1基板」、「第2基板」、「第3基板」、・・・と、それぞれ呼称して、区別する。なお、積層型の固体撮像装置は、各基板がウエハの状態で積層された後、複数個の積層型固体撮像装置（即ち、積層型固体撮像装置チップ）へとダイシングされることにより、製造される。本明細書では、便宜的に、「基板」とは、ダイシング前のウエハの状態も意味し得るし、ダイシング後のチップの状態も意味し得ることとする。

先行技術文献

特許文献

[0004] 特許文献1：特開2014-99582号公報

発明の概要

発明が解決しようとする課題

[0005] 特許文献 1 に記載されているような積層型の固体撮像装置においては、上下の基板に備わる信号線間及び電源線間の電気的な接続方法として、いくつかの方法が考案されている。例えば、パッドを介してチップの外部で接続する方法や、TSV (Through-Silicon Via) によってチップの内部で接続する方法等が存在する。これまで、この基板に備わる信号線間及び電源線間の電気的な接続方法のバリエーションについては、必ずしも詳細な検討が行われているとは言えなかった。かかるバリエーションについて詳細に検討を行うことにより、より高性能な固体撮像装置を得るための適切な構造についての知見が得られる可能性がある。

[0006] そこで、本開示では、性能をより向上させることが可能な、新規かつ改良された固体撮像装置及び電子機器を提案する。

課題を解決するための手段

[0007] 本開示によれば、画素が配列された画素部が形成された第 1 半導体基板と、前記第 1 半導体基板上に積層された第 1 多層配線層と、を有する第 1 基板と、所定の機能を有する回路が形成された第 2 半導体基板と、前記第 2 半導体基板上に積層された第 2 多層配線層と、を有する第 2 基板と、所定の機能を有する回路が形成された第 3 半導体基板と、前記第 3 半導体基板上に積層された第 3 多層配線層と、を有する第 3 基板と、がこの順に積層されて構成され、前記第 1 基板と前記第 2 基板とは、前記第 1 多層配線層と前記第 2 半導体基板とが対向するように貼り合わされ、前記第 1 基板の回路と前記第 2 基板の回路とを電気的に接続するための第 1 の接続構造を有し、前記第 1 の接続構造は、前記第 1 多層配線層内の所定の配線を露出させる第 1 の貫通孔と、前記第 2 多層配線層内の所定の配線を露出させる前記第 1 の貫通孔とは異なる第 2 の貫通孔と、に導電材料が埋め込まれた構造、又は前記第 1 の貫通孔及び前記第 2 の貫通孔の内壁に導電材料が成膜された構造、を有するビア、を含む、固体撮像装置が提供される。

[0008] また、本開示によれば、観察対象を電子的に撮影する固体撮像装置、を備え、前記固体撮像装置は、画素が配列された画素部が形成された第 1 半導体

基板と、前記第 1 半導体基板上に積層された第 1 多層配線層と、を有する第 1 基板と、所定の機能を有する回路が形成された第 2 半導体基板と、前記第 2 半導体基板上に積層された第 2 多層配線層と、を有する第 2 基板と、所定の機能を有する回路が形成された第 3 半導体基板と、前記第 3 半導体基板上に積層された第 3 多層配線層と、を有する第 3 基板と、がこの順に積層されて構成され、前記第 1 基板と前記第 2 基板とは、前記第 1 多層配線層と前記第 2 半導体基板とが対向するように貼り合わされ、前記第 1 基板の回路と前記第 2 基板の回路とを電氣的に接続するための第 1 の接続構造を有し、前記第 1 の接続構造は、前記第 1 多層配線層内の所定の配線を露出させる第 1 の貫通孔と、前記第 2 多層配線層内の所定の配線を露出させる前記第 1 の貫通孔とは異なる第 2 の貫通孔と、に導電材料が埋め込まれた構造、又は前記第 1 の貫通孔及び前記第 2 の貫通孔の内壁に導電材料が成膜された構造、を有するビア、を含む、電子機器が提供される。

[0009] 本開示によれば、積層される各基板に備えられる信号線及び電源線を、より適切な電氣的な接続方法によってそれぞれ接続することが可能である。

発明の効果

[0010] 以上説明したように本開示によれば、固体撮像装置の性能をより向上させることが可能になる。なお、上記の効果は必ずしも限定的なものではなく、上記の効果とともに、または上記の効果に代えて、本明細書に示されたいずれかの効果、または本明細書から把握され得る他の効果が奏されてもよい。

図面の簡単な説明

[0011] [図1]本開示の一実施形態に係る固体撮像装置の概略構成を示す縦断面図である。

[図2A]固体撮像装置における接続構造の水平面内での配置の一例について説明するための図である。

[図2B]固体撮像装置における接続構造の水平面内での配置の一例について説明するための図である。

[図2C]固体撮像装置における接続構造の水平面内での配置の他の例について

説明するための図である。

[図2D]固体撮像装置における接続構造の水平面内での配置の他の例について説明するための図である。

[図2E]固体撮像装置における接続構造の水平面内での配置の更に他の例について説明するための図である。

[図2F]固体撮像装置における接続構造の水平面内での配置の更に他の例について説明するための図である。

[図3A]第1基板と第2基板とがF t o Fで貼り合わされた固体撮像装置の概略構成を示す縦断面図である。

[図3B]第1基板と第2基板とがF t o Bで貼り合わされた固体撮像装置の概略構成を示す縦断面図である。

[図4A]図3Aに示す固体撮像装置における、P W E L Lと電源配線との間の寄生容量について説明するための図である。

[図4B]図3Bに示す固体撮像装置における、P W E L Lと電源配線との間の寄生容量について説明するための図である。

[図5A]図3Aに示す固体撮像装置における、電源配線及びG N D配線の配置を概略的に示す図である。

[図5B]図3Bに示す固体撮像装置における、電源配線及びG N D配線の配置を概略的に示す図である。

[図5C]図5Aに示す固体撮像装置におけるインピーダンスを低下させるための一構成例を示す図である。

[図6A]第1の構成例に係る固体撮像装置の一例を示す縦断面図である。

[図6B]第1の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

[図6C]第1の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

[図6D]第1の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

[図6E]第1の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

[図6F]第1の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

[図6G]第1の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

[図7A]第2の構成例に係る固体撮像装置の一例を示す縦断面図である。

[図7B]第2の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

[図7C]第2の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

[図7D]第2の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

[図7E]第2の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

[図7F]第2の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

[図7G]第2の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

[図7H]第2の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

[図7I]第2の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

[図7J]第2の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

[図7K]第2の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

[図7L]第2の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

[図7M]第2の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

[図7N]第2の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

[図7O]第2の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

[図7P]第2の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

[図8A]第3の構成例に係る固体撮像装置の一例を示す縦断面図である。

[図8B]第3の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

[図8C]第3の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

[図8D]第3の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

[図8E]第3の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

[図8F]第3の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

[図8G]第3の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

[図8H]第3の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

[図8I]第3の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

[図8J]第3の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

[図9A]第4の構成例に係る固体撮像装置の一例を示す縦断面図である。

[図9B]第4の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

[図9C]第4の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

[図9D]第4の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

[図9E]第4の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

[図9F]第4の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

[図9G]第4の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

[図9H]第4の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

[図10A]第5の構成例に係る固体撮像装置の一例を示す縦断面図である。

[図10B]第5の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

[図10C]第5の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

[図10D]第5の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

[図10E]第5の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

[図10F]第5の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

[図10G]第5の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

[図10H]第5の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

[図10I]第5の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

[図10J]第5の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

[図11A]第6の構成例に係る固体撮像装置の一例を示す縦断面図である。

[図11B]第6の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

[図11C]第6の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

[図11D]第6の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

[図11E]第6の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

[図11F]第6の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

[図11G]第6の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

[図11H]第6の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

[図12A]第7の構成例に係る固体撮像装置の一例を示す縦断面図である。

[図12B]第7の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

[図12C]第7の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

[図12D]第7の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

〔図12E〕第7の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

〔図12F〕第7の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

〔図12G〕第7の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

[図12H]第7の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

〔図12I〕第7の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

〔図12J〕第7の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

【図12K】第7の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

〔図12L〕第7の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

【図12M】第7の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

【図12N】第7の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

【図120】第7の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

〔図12P〕第7の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

【図13A】第8の構成例に係る固体撮像装置の一例を示す縦断面図である。

【図13B】第8の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

【図13C】第8の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

【図13D】第8の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

【図13E】第8の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

【図13F】第8の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

【図13G】第8の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

【図13H】第8の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

【図13I】第8の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

【図13J】第8の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

〔図14A〕第9の構成例に係る固体撮像装置の一例を示す縦断面図である。

【図14B】第9の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

〔図14C〕第9の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

【図14D】第9の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

〔図14E〕第9の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

【図14F】第9の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

[図14G]第9の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

[図14H]第9の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

[図14I]第9の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

[図14J]第9の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

[図14K]第9の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

[図14L]第9の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

[図14M]第9の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

[図14N]第9の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

[図14O]第9の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

[図14P]第9の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

[図15A]第10の構成例に係る固体撮像装置の一例を示す縦断面図である。

[図15B]第10の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

[図15C]第10の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

[図15D]第10の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

[図15E]第10の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

[図15F]第10の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

[図15G]第10の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

[図15H]第10の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

[図15I]第10の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

[図15J]第10の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

[図16A]第11の構成例に係る固体撮像装置の一例を示す縦断面図である。

[図16B]第11の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

[図16C]第11の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

[図17A]第12の構成例に係る固体撮像装置の一例を示す縦断面図である。

[図17B]第12の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

[図17C]第12の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

[図17D]第12の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

[図17E]第12の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

[図17F]第12の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

[図18A]第13の構成例に係る固体撮像装置の一例を示す縦断面図である。

[図18B]第13の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

[図18C]第13の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

[図18D]第13の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

[図18E]第13の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

[図19A]第14の構成例に係る固体撮像装置の一例を示す縦断面図である。

[図19B]第14の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

[図19C]第14の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

[図19D]第14の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

[図19E]第14の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

[図19F]第14の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

[図20A]第15の構成例に係る固体撮像装置の一例を示す縦断面図である。

[図20B]第15の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

[図20C]第15の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

[図20D]第15の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

[図20E]第15の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

[図21A]第16の構成例に係る固体撮像装置の一例を示す縦断面図である。

[図21B]第16の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

[図21C]第16の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

[図22A]第17の構成例に係る固体撮像装置の一例を示す縦断面図である。

[図22B]第17の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

[図22C]第17の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

[図22D]第17の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

[図22E]第17の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

[図22F]第17の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

[図23A]第18の構成例に係る固体撮像装置の一例を示す縦断面図である。

[図23B]第18の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

[図23C]第18の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

[図23D]第18の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

[図23E]第18の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

[図24A]第19の構成例に係る固体撮像装置の一例を示す縦断面図である。

[図24B]第19の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

[図24C]第19の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

[図24D]第19の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

[図24E]第19の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

[図24F]第19の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

[図25A]第20の構成例に係る固体撮像装置の一例を示す縦断面図である。

[図25B]第20の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

[図25C]第20の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

[図25D]第20の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

[図25E]第20の構成例に係る固体撮像装置の他の例を示す縦断面図である。

[図26A]本実施形態に係る固体撮像装置1～25Eが適用され得る電子機器の一例である、スマートフォンの外観を示す図である。

[図26B]本実施形態に係る固体撮像装置1～25Eが適用され得る電子機器の他の例である、デジタルカメラの外観を示す図である。

[図26C]本実施形態に係る固体撮像装置1～25Eが適用され得る電子機器の他の例である、デジタルカメラの外観を示す図である。

[図27A]本開示に係る技術を適用し得る固体撮像装置の構成例を示す断面図である。

[図27B]本開示に係る技術が適用され得る固体撮像装置の概略構成を示す説明図である。

[図27C]本開示に係る技術が適用され得るビデオカメラの構成例を示す説明図である。

[図27D]内視鏡手術システムの概略的な構成の一例を示す図である。

[図27E]カメラヘッド及びCCUの機能構成の一例を示すブロック図である。

[図27F]車両制御システムの概略的な構成の一例を示すブロック図である。

[図27G]車外情報検出部及び撮像部の設置位置の一例を示す説明図である。

発明を実施するための形態

[0012] 以下に添付図面を参照しながら、本開示の好適な実施の形態について詳細に説明する。なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。

[0013] なお、説明は以下の順序で行うものとする。

1. 固体撮像装置の全体構成
2. 接続構造の配置について
3. 第2基板の方向について
 - 3-1. P W E L Lの面積に基づく検討
 - 3-2. 消費電力及びG N D配線の配置に基づく検討
4. 接続構造のバリエーション
 - 4-1. 第1の構成例
 - 4-2. 第2の構成例
 - 4-3. 第3の構成例
 - 4-4. 第4の構成例
 - 4-5. 第5の構成例
 - 4-6. 第6の構成例
 - 4-7. 第7の構成例
 - 4-8. 第8の構成例
 - 4-9. 第9の構成例
 - 4-10. 第10の構成例
 - 4-11. 第11の構成例
 - 4-12. 第12の構成例
 - 4-13. 第13の構成例
 - 4-14. 第14の構成例

4－15．第15の構成例

4－16．第16の構成例

4－17．第17の構成例

4－18．第18の構成例

4－19．第19の構成例

4－20．第20の構成例

5．適用例

6．補足

[0014] (1．固体撮像装置の全体構成)

図1は、本開示の一実施形態に係る固体撮像装置の概略構成を示す縦断面図である。図1に示すように、本実施形態に係る固体撮像装置1は、第1基板110Aと、第2基板110Bと、第3基板110Cと、が積層されて構成される、3層積層型の固体撮像装置である。図中において、破線A－Aは、第1基板110Aと第2基板110Bとの貼り合わせ面を示しており、破線B－Bは、第2基板110Bと第3基板110Cとの貼り合わせ面を示している。第1基板110Aは、画素部が設けられる画素基板である。第2基板110B及び第3基板110Cには、固体撮像装置1の動作に係る各種の信号処理を行うための回路が設けられる。第2基板110B及び第3基板110Cは、例えば、ロジック回路が設けられるロジック基板又はメモリ回路が設けられるメモリ基板である。固体撮像装置1は、第1基板110Aの後述する裏面側から入射した光を画素部において光電変換する、裏面照射型のCMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor) イメージセンサである。なお、以下、図1についての説明では、一例として、第2基板110Bがロジック基板であり、第3基板110Cがメモリ基板である場合について説明する。

[0015] 積層型の固体撮像装置1では、各基板の機能に対応するように、各回路をより適切に構成することが可能であるため、固体撮像装置1の高機能化をより容易に実現することができる。図示する構成例であれば、第1基板110

Aにおける画素部と、第2基板110B及び第3基板110Cにおけるロジック回路又はメモリ回路と、を各基板の機能に対応するように適切に構成することができるため、高機能な固体撮像装置1を実現することができる。

[0016] なお、以下では、第1基板110A、第2基板110B及び第3基板110Cの積層方向をz軸方向とも呼称する。また、z軸方向において第1基板110Aが位置する方向をz軸の正方向と定義する。また、z軸方向と垂直な面（水平面）上において互いに直交する2方向を、それぞれ、x軸方向及びy軸方向とも呼称する。また、以下では、各基板において、後述する半導体基板101、121、131が基板主面方向に対向して備える2つの面のうち、トランジスタなどの機能部品が設けられる側の面、又は当該機能部品を動作させる後述する多層配線層105、125、135が設けられる一側の面を表面（フロントサイドサーフェイスともいう）とも呼称し、当該表面に対向する他側の面を裏面（バックサイドサーフェイス）とも呼称する。

[0017] 第1基板110Aは、例えばシリコン（Si）からなる半導体基板101と、当該半導体基板101上に形成される多層配線層105と、を主に有する。半導体基板101上には、画素が所定の配置に並べられた画素部と、画素信号を処理する画素信号処理回路と、が主に形成される。各画素は、観察対象からの光（観察光）を受光し光電変換するフォトダイオード（PD）と、当該PDによって取得された観察光に対応する電気信号（画素信号）を読み出すためのトランジスタ等を有する駆動回路と、から主に構成される。画素信号処理回路において、画素信号に対して、例えばアナログーデジタル変換（AD変換）等の各種の信号処理が実行される。なお、第1基板110Aは、半導体基板101に替えて、半導体以外の材料を用いて形成した基板を用いることも可能である。例えば、第1基板110Aは、半導体以外の材料の基板であるサファイア基板の上に、光電変換を行う膜（例えば、一般的な有機光電変換膜）を成膜して画素を形成した形態であってもよい。

[0018] 画素部及び画素信号処理回路が形成された半導体基板101の表面側には、絶縁膜103が積層される。絶縁膜103の内部には、画素信号、及び駆

動回路のトランジスタを駆動するための駆動信号等の各種の信号を伝達するための多層配線層 105 が形成される。多層配線層 105 には、更に、電源配線やグランド配線（GND 配線）等が含まれる。多層配線層 105 の最下層の配線は、例えばタングステン（W）等の導電材料が埋め込まれたコンタクト 107 によって、画素部又は画素信号処理回路と電氣的に接続され得る。なお、実際には、所定の厚さの層間絶縁膜の形成と、金属膜の形成及びパターンニングと、を繰り返すことにより、複数層の配線層が形成され得るが、図 1 では、簡単のため、これら複数層の層間絶縁膜を絶縁膜 103 と総称し、複数層の配線層を多層配線層 105 と総称する。

[0019] なお、多層配線層 105 には、外部との間で各種の信号のやり取りを行うための外部入出力部（I/O 部）として機能するパッド 151 が形成され得る。パッド 151 は、チップの外周に沿って設けられ得る。

[0020] 第 2 基板 110B は、例えばロジック基板である。第 2 基板 110B は、例えば Si からなる半導体基板 121 と、当該半導体基板 121 上に形成される多層配線層 125 と、を主に有する。半導体基板 121 上には、ロジック回路が形成される。当該ロジック回路では、固体撮像装置 1 の動作に係る各種の信号処理が実行される。例えば、当該ロジック回路では、第 1 基板 110A の画素部を駆動するための駆動信号の制御（すなわち、画素部の駆動制御）や、外部との信号のやり取りが制御され得る。なお、第 2 基板 110B は、半導体基板 121 に替えて、半導体以外の材料を用いて形成した基板を用いることも可能である。例えば、第 2 基板 110B は、半導体以外の材料の基板であるサファイア基板の上に、回路素子が形成可能な半導体膜（例えば、シリコン膜など）を成膜して回路を形成した形態であってもよい。

[0021] ロジック回路が形成された半導体基板 121 の表面側には、絶縁膜 123 が積層される。絶縁膜 123 の内部には、ロジック回路の動作に係る各種の信号を伝達するための多層配線層 125 が形成される。多層配線層 125 には、更に、電源配線や GND 配線等が含まれる。多層配線層 125 の最下層の配線は、例えば W 等の導電材料が埋め込まれたコンタクト 127 によって

、ロジック回路と電氣的に接続され得る。なお、第1基板110Aの絶縁膜103及び多層配線層105と同様に、第2基板110Bについても、絶縁膜123は複数層の層間絶縁膜の総称であり、多層配線層125は複数層の配線層の総称であり得る。

[0022] なお、半導体基板121の裏面側には、所定の厚さの絶縁膜129が形成される。また、第2基板110Bには、第1基板110Aの多層配線層105内の配線と、第2基板110Bの多層配線層125内の配線と、を電氣的に接続するTSV157が形成され得る。具体的には、TSV157は、第2基板110Bの表面側から半導体基板121を貫通して設けられ、第1基板110Aの多層配線層105内の配線を露出させる第1の貫通孔と、第2基板110Bの多層配線層125内の配線を露出させ、かつ第1の貫通孔とは異なる第2の貫通孔と、に導電材料が埋め込まれた構造を有する構造にて形成され得る。

[0023] 第3基板110Cは、例えばメモリ基板である。第3基板110Cは、例えばSiからなる半導体基板131と、当該半導体基板131上に形成される多層配線層135と、を主に有する。半導体基板131上には、メモリ回路が形成される。当該メモリ回路では、第1基板110Aの画素部で取得され、画素信号処理回路によってAD変換された画素信号が、一時的に保持される。メモリ回路に画素信号を一旦保持することにより、グローバルシャッター方式が実現されるとともに、固体撮像装置1から外部への当該画素信号の読み出しをより高速で行うことが可能になる。従って、高速撮影時においても、歪みの抑制された、より高品質な画像を撮影することが可能になる。なお、第3基板110Cは、半導体基板131に替えて、半導体以外の材料を用いて形成した基板を用いることも可能である。例えば、第3基板110Cは、半導体以外の材料の基板であるサファイア基板の上に、メモリ素子が形成可能な膜（例えば、相変化材料膜など）を成膜して回路を形成した形態であってもよい。

[0024] メモリ回路が形成された半導体基板131の表面側には、絶縁膜133が

積層される。絶縁膜 133 の内部には、メモリ回路の動作に係る各種の信号を伝達するための多層配線層 135 が形成される。多層配線層 135 には、更に、電源配線や GND 配線等が含まれる。多層配線層 135 の最下層の配線は、例えば W 等の導電材料が埋め込まれたコンタクト 137 によって、メモリ回路と電氣的に接続され得る。なお、第 1 基板 110A の絶縁膜 103 及び多層配線層 105 と同様に、第 3 基板 110C についても、絶縁膜 133 は複数層の層間絶縁膜の総称であり、多層配線層 135 は複数層の配線層の総称であり得る。

[0025] なお、多層配線層 135 には、外部との間で各種の信号のやり取りを行うための I/O 部として機能するパッド 151 が形成され得る。パッド 151 は、チップの外周に沿って設けられ得る。

[0026] 第 1 基板 110A、第 2 基板 110B、及び第 3 基板 110C が、それぞれウエハの状態で作製される。その後、これらが貼り合わされ、第 1 基板 110A、第 2 基板 110B、及び第 3 基板 110C にそれぞれ備えられる信号線同士及び電源線同士を電氣的に接続するための各工程が行われる。

[0027] 具体的には、まず、ウエハ状態の第 2 基板 110B の表面（多層配線層 125 が設けられる側の面）と、ウエハ状態の任意のダミー基板の一面と、が対向するように、当該第 2 基板 110B と当該ダミー基板とが貼り合わされる。次に、第 2 基板 110B の裏面（多層配線層 125 が設けられる側の面と対向する面）を薄肉化した後、貼り合わされた第 2 基板 110B の裏面には、所定の厚さの絶縁膜 129 が形成される。続いて、ウエハ状態の第 2 基板 110B の裏面（多層配線層 125 が設けられる側の面と対向する面）と、ウエハ状態の第 1 基板 110A の表面（多層配線層 105 が設けられる側の面）と、が対向するように、第 2 基板 110B およびダミー基板の積層体と当該第 1 基板 110A とが貼り合わされる。以下では、このような、2 つの基板が表面と裏面を対向させて貼り合わされる状態を、Face to Back (Ft o B) ともいう。その後、ダミー基板は、第 1 基板 110A 及び第 2 基板 110B の積層体から剥離される。

[0028] 続いて、第2基板110Bの表面側から、第1基板110Aの多層配線層105内の配線の接続面まで達する第1の貫通孔と、第2基板110Bの多層配線層125内の配線の接続面まで達する第2の貫通孔とを備えるTSV157が形成される。具体的には、TSV157は、第2基板110Bの表面側から第2基板110Bを貫通し、第1基板110Aの多層配線層105内の配線を露出させる第1の貫通孔と、第2基板110Bの表面側から第2基板110Bの多層配線層125内の配線を露出させる第2の貫通孔とに、導電材料を埋め込むことで形成される。このような、それぞれ異なる多層配線層内の配線を2つの貫通孔によってそれぞれ露出させ、該2つの貫通孔に導電材料を埋め込むことで形成されるTSV157は、例えば、ツインコンタクト(twin contact)とも称される。TSV157を介して、第1基板110Aの多層配線層105内の配線と、第2基板110Bの多層配線層125内の配線とが電氣的に接続される。

[0029] 次に、第2基板110Bの表面(多層配線層125が設けられる側の面)と、第3基板110Cの表面(多層配線層135が設けられる側の面)と、が対向するように、第1基板110A及び第2基板110Bの積層体と、ウエハ状態の第3基板110Cと、がさらに貼り合わされる。以下では、このような、2つの基板が表面と表面とを対向させて貼り合わされる状態を、Face to Face(FtoF)ともいう。

[0030] なお、TSV157は、第2基板110Bの多層配線層125に含まれる配線と接触し、第1基板110Aの多層配線層105に含まれる配線を露出させる1つの貫通孔に、導電材料を埋め込むことで形成することも可能である。例えば、このようなTSV157は、第2基板110Bの裏面側から第2基板110Bを貫通して設けられ、多層配線層125に含まれる配線の少なくとも側面を露出させ、多層配線層105に含まれる配線の上面を露出させる貫通孔を導電材料で埋め込んだ構造にて形成され得る。このようなTSV157は、例えば、シェアードコンタクト(shared contact)とも称される。また、シェアードコンタクト構造のTSV157は、第

2 基板 1 1 0 B の多層配線層 1 2 5 内の複数の配線と両側で接触してもよく、第 2 基板 1 1 0 B の多層配線層 1 2 5 内の一つの配線と片側で接触してもよい。以下で説明する他のシェアドコンタクト構造の T S V 1 5 7 についても同様に、T S V 1 5 7 は、多層配線層 1 0 5、1 2 5、1 3 5 内の配線と両側または片側のいずれにて接触していてもよい。

[0031] 以上にて形成された第 1 基板 1 1 0 A、第 2 基板 1 1 0 B、及び第 3 基板 1 1 0 C の積層構造体に対して、第 1 基板 1 1 0 A の半導体基板 1 0 1 の裏面側に、絶縁膜 1 0 9 を介して、カラーフィルタ層 1 1 1 (C F 層 1 1 1) 及びマイクロレンズアレイ 1 1 3 (M L アレイ 1 1 3) が形成される。

[0032] C F 層 1 1 1 は、複数の C F が画素に対応するように配列されて構成される。M L アレイ 1 1 3 は、複数の M L が画素に対応するように配列されて構成される。C F 層 1 1 1 及び M L アレイ 1 1 3 は、画素部の直上に形成され、1 つの画素の P D に対して 1 つの C F 及び 1 つの M L が配設される。

[0033] C F 層 1 1 1 の各 C F は、例えば赤色、緑色、及び青色のいずれかの色を有する。C F を通過した観察光が画素の P D に入射し、画素信号が取得されることにより、観察対象について、当該カラーフィルタの色の成分の画素信号が取得されることとなる（すなわち、カラーでの撮像が可能となる）。実際には、1 つの C F に対応する 1 つの画素が副画素として機能し、複数の副画素によって 1 つの画素が形成され得る。例えば、固体撮像装置 1 では、赤色の C F が設けられる画素（すなわち、赤色の画素）、緑色の C F が設けられる画素（すなわち、緑色の画素）、青色の C F が設けられる画素（すなわち、青色の画素）、及び C F が設けられない画素（すなわち、白色の画素）の 4 色の副画素によって、1 つの画素が形成され得る。ただし、本明細書では、説明のため、便宜的に、副画素と画素を区別せず、1 つの副画素に対応する構成のことも、単に画素と呼称することとする。なお、C F の配列方法は特に限定されず、例えば、デルタ配列、ストライプ配列、ダイアゴナル配列、又はレクタングル配列等、各種の配列であってよい。

[0034] M L アレイ 1 1 3 は、各 C F の直上に各 M L が位置するように形成される

。ML アレイ 113 が設けられることにより、ML によって集光された観察光がCF を介して画素のPD に入射することとなるため、観察光の集光効率を向上させ、固体撮像装置 1 としての感度を向上させる効果を得ることができる。

[0035] そして、第 1 基板 110A の多層配線層 105、及び第 3 基板 110C の多層配線層 135 に設けられるパッド 151 の外部入力との接続面を露出させるために、パッド開口部 153a、153b が形成される。パッド開口部 153a は、第 1 基板 110A の裏面側から、半導体基板 101 を貫通し、第 1 基板 110A の多層配線層 105 に設けられるパッド 151 の接続面まで達するように形成される。パッド開口部 153b は、第 1 基板 110A の裏面側から、第 1 基板 110A 及び第 2 基板 110B を貫通し、第 3 基板 110C の多層配線層 135 に設けられるパッド 151 の接続面まで達するように形成される。パッド開口部 153a、153b を介して、例えばワイヤボンディングによって、パッド 151 の接続面と外部の他の回路とが電氣的に接続される。つまり、当該外部の回路を介して、第 1 基板 110A 内の各種配線、及び第 3 基板 110C 内の各種配線が電氣的に接続され得る。

[0036] このように、固体撮像装置 1 では、TSV 157 を介して、第 1 基板 110A 内の各種配線、及び第 2 基板 110B 内の各種配線が電氣的に接続される。また、固体撮像装置 1 では、固体撮像装置 1 の外部に備わる配線や基板などの電氣的接続手段を介して、パッド 151 を接続することによって、第 1 基板 110A 内の各種配線、及び第 3 基板 110C 内の各種配線が電氣的に接続され得る。これにより、第 1 基板 110A、第 2 基板 110B 及び第 3 基板 110C の各々に備わる、信号を伝達するための信号配線が複数の基板に亘って相互に電氣的に接続され得る。同様にして、第 1 基板 110A、第 2 基板 110B、及び第 3 基板 110C の各々に備わる、電源を供給するための電源配線（さらには、グランド（GND）に地絡する GND 配線）が、複数の基板に渡って相互に電氣的に接続され得る。

[0037] なお、以下では、簡略化のため、信号配線、電源配線、および GND 配線

などの各種配線を併せて単に「配線」と記載する場合もある。本明細書では、図1に示すTSV157（ツインコンタクトおよびシェアードコンタクトも含む）、パッド151、及びパッド開口部153a、153bのような、基板同士に備えられる各種配線（例えば、信号線及び電源線）を電氣的に接続する構造のことを、接続構造とも総称する。ただし、前述のように本実施形態において、半導体基板101、121、131は、シリコン等の半導体以外の材料を用いることも可能であるため、本明細書で呼称されるTSVは、基板を貫通して設けられるものを表し、基板の材質については特に限定していないものとする。なお、図1に示す構成では用いられていないが、後述する電極接合構造（第1基板110Aと第2基板110Bとの貼り合わせ面、又は第2基板110Bと第3基板110Cとの貼り合わせ面にそれぞれ形成される電極同士が直接接触した状態で接合された構造）も接続構造に含まれる。電極接合構造は、例えば、一方の基板の多層配線層の最上層に形成された電極と、他方の基板の多層配線層の最上層に形成された電極とを直接接触させた状態で熱処理し、互いの電極を接合させることで形成される構造である。電極接合構造は、貼り合わせ面に電極接合構造が形成された基板同士に備えられる配線の各々を互いに電氣的に接続する。

[0038] なお、第1基板110Aの多層配線層105、第2基板110Bの多層配線層125、及び第3基板110Cの多層配線層135は、比較的低抵抗である第1の金属によって形成される複数の第1金属配線層141が含まれる。第1の金属は例えば銅（Cu）である。Cu配線を用いることにより、より高速での信号のやり取りが可能となる。ただし、パッド151については、ワイヤボンディングのワイヤとの接着性等を考慮して、第1の金属とは異なる第2の金属によって形成され得る。従って、第1基板110Aの多層配線層105、第2基板110Bの多層配線層125、及び第3基板110Cの多層配線層135には、パッド151と同層に、第2の金属によって形成される第2金属配線層143が含まれ得る。第2の金属は例えばアルミニウム（Al）である。Al配線は、パッド151の他、例えば、一般的に幅広

な配線として形成される電源配線やGND配線として用いられ得る。また、コンタクト107、127、137については、成膜時の充填性等を考慮して、第1の金属及び第2の金属とは異なる第3の金属によって形成され得る。第3の金属は例えばタングステン(W)である。Wビアは、成膜時の充填性が高いため、より小さな開口のビアとして形成し得る。Wビアを用いることで、例えば、より微細な大きさ及び間隔で設けられるファインピッチビアを容易に形成することが可能である。

[0039] なお、第1の金属、第2の金属及び第3の金属は、上記で例示したCu、Al及びWに限定されない。第1の金属、第2の金属及び第3の金属としては、各種の金属が用いられてよい。あるいは、多層配線層105、125、135に含まれる各配線層は、金属以外の導電材料によって形成されてもよい。これらの配線層は、導電材料によって形成されればよく、その材料は限定されない。また、2種類の導電材料を用いるのではなく、多層配線層105、125、135のパッド151を含む全ての配線層が同一の導電材料によって形成されてもよい。

[0040] なお、本実施形態では、後述する電極接合構造を構成する電極及びビアは、第1の金属（例えばCu）によって形成され得る。例えば、第1の金属がCuである場合、これらの構造は、シングルダマシン法、又はデュアルダマシン法によって形成され得る。ただし、本実施形態はかかる例に限定されず、これらの構造のうちの一部又は全てが、第1の金属及び第2の金属のいずれとも異なる他の金属、又は他の非金属の導電材料によって形成されてもよい。

[0041] ここで、図1及び以降の各図面においては図示を省略している場合があるが、固体撮像装置1において、第1の金属及び第2の金属等の導電材料が半導体基板101、121、131と接触している部位については、この両者を電氣的に絶縁するための絶縁材料が存在している。当該絶縁材料は、例えば、SiO₂又はSiN等、各種の公知の材料であってよい。当該絶縁材料は、導電材料と半導体基板101、121、131との間に介在するように存

在してもよいし、両者の接触部位から離れた半導体基板101、121、131の内部に存在してもよい。例えば、TSV157については、半導体基板101、121、131に設けられる貫通孔の内側壁と、当該貫通孔に埋め込まれる導電材料との間に、絶縁材料が存在し得る（すなわち、当該貫通孔の内側壁に絶縁材料が成膜され得る）。あるいは、TSV157については、半導体基板101、121、131の内部の部位であって、当該半導体基板101、121、131に設けられる貫通孔から水平面内方向に所定の距離だけ離れた部位に、絶縁材料が存在していてもよい。

[0042] このようにしてウエハ状態で積層された後、加工された積層構造体を固体撮像装置1ごとにダイシングすることにより、固体撮像装置1が完成する。

[0043] 以上、固体撮像装置1の概略構成について説明した。なお、各基板の半導体基板101、121、131に形成される各構成（第1基板110Aに設けられる画素部及び画素信号処理回路、第2基板110Bに設けられるロジック回路、及び第3基板110Cに設けられるメモリ回路）、多層配線層105、125、135、並びに絶縁膜103、109、123、129、133の具体的な構成や、形成方法は、各種の公知のものと同様であってよい。ため、ここでは詳細な説明を省略する。

[0044] 例えば、絶縁膜103、109、123、129、133は、絶縁性を有する材料によって形成されればよく、その材料は限定されない。絶縁膜103、109、123、129、133は、例えば、シリコン酸化物（ SiO_2 ）、シリコン窒化物（ SiN ）等によって形成され得る。また、絶縁膜103、109、123、129、133のそれぞれは、1つの種類の絶縁材料によって形成されなくてもよく、複数の種類の絶縁材料が積層されて形成されてもよい。また、例えば、絶縁膜103、123、133において、より高速での信号の伝達を実現するためには、絶縁性を有し、比誘電率が低いLow-k材料が用いられてもよい。Low-k材料を用いることにより、配線間の寄生容量を小さくすることができるため、信号伝送の高速化にさらに寄与することが可能になる。

[0045] その他、各基板の半導体基板 101、121、131 に形成される各構成、多層配線層 105、125、135、及び絶縁膜 103、109、123、129、133 の具体的な構成や形成方法については、例えば、本願出願人による先行出願である特許文献 1 に記載のものを適宜適用することができる。

[0046] また、以上説明した構成例では、第 1 基板 110A に、画素信号に対して AD 変換などの信号処理を行う画素信号処理回路が搭載されていたが、本実施形態はかかる例に限定されない。当該画素信号処理回路の機能のうちの一部又は全てが、第 2 基板 110B に設けられてもよい。この場合には、例えば、複数の画素を列（カラム）方向および行（ロウ）方向の双方にアレイ状に配列させた画素アレイにおいて、各画素に備えられる PD によって取得された画素信号が、画素ごとに第 2 基板 110B の画素信号処理回路に伝送されて、画素ごとに AD 変換が行われる、いわゆる画素毎アナログーデジタル変換（画素 ADC）方式の固体撮像装置が実現され得る。これにより、画素アレイの列ごとに 1 つの AD 変換回路を備え、列に含まれる複数の画素の AD 変換を逐次行う、一般的なカラム毎アナログーデジタル変換（カラム ADC）方式の固体撮像装置に比べて、より高速で画素信号の AD 変換及び読み出しを行うことが可能となる。なお、画素 ADC を実行可能に固体撮像装置 1 を構成する場合には、画素ごとに、第 1 基板 110A の信号線及び電源線と第 2 基板 110B の信号線及び電源線とを電氣的に接続する電極接合構造が設けられることとなる。

[0047] また、以上説明した構成例では、第 2 基板 110B がロジック基板であり、第 3 基板 110C がメモリ基板である場合について説明したが、本実施形態はかかる例に限定されない。第 2 基板 110B 及び第 3 基板 110C は画素基板以外の機能を有する基板であればよく、その機能は任意に決定されてよい。例えば、固体撮像装置 1 は、メモリ回路を有しなくてもよい。この場合には、例えば、第 2 基板 110B 及び第 3 基板 110C は、いずれもロジック基板として機能し得る。あるいは、ロジック回路及びメモリ回路が、第

2 基板 1 1 0 B 及び第 3 基板 1 1 0 C に分散して形成され、これらの基板が協働して、ロジック基板及びメモリ基板としての機能を果たしてもよい。または、第 2 基板 1 1 0 B はメモリ基板であり、第 3 基板 1 1 0 C はロジック基板であってもよい。

[0048] また、以上説明した構成例では、各基板において、半導体基板 1 0 1、1 2 1、1 3 1 として S i 基板が用いられていたが、本実施形態はかかる例に限定されない。半導体基板 1 0 1、1 2 1、1 3 1 としては、例えば、ガリウムヒ素 (G a A s) 基板や、シリコンカーバイド (S i C) 基板等、他の種類の半導体基板が用いられてもよい。また、半導体基板 1 0 1、1 2 1、1 3 1 に替えて、サファイア基板等の非半導体材料からなる基板が用いられてもよい。

[0049] (2. 接続構造の配置について)

図 1 を参照して説明したように、固体撮像装置 1 では、第 1 基板 1 1 0 A、第 2 基板 1 1 0 B および第 3 基板 1 1 0 C のいずれかに設けられたパッド 1 5 1 は、固体撮像装置 1 の外部に備えられる配線および基板などの電氣的接続手段によって、互いに接続する接続構造となっている。したがって、第 1 基板 1 1 0 A、第 2 基板 1 1 0 B および第 3 基板 1 1 0 C に備えられる信号線及び電源線は、これらの接続構造を介することで、複数の基板に亘って相互に電氣的に接続し得る。これらの接続構造の水平面内での配置は、各基板 (各チップ) の構成、性能等を考慮して、固体撮像装置 1 全体としての性能が向上し得るように、適宜決定され得る。ここでは、固体撮像装置 1 における接続構造の水平面内での配置のいくつかのバリエーションについて説明する。

[0050] 図 2 A 及び図 2 B は、固体撮像装置 1 における接続構造の水平面内での配置の一例について説明するための図である。図 2 A 及び図 2 B は、例えば、固体撮像装置 1 において、第 1 基板 1 1 0 A に画素信号に対して A D 変換等の処理を行う画素信号処理回路が搭載される場合における、接続構造の配置を示している。

[0051] 図2Aでは、固体撮像装置1を構成する第1基板110A、第2基板110B、及び第3基板110Cを概略的に示している。そして、第1基板110Aの下面（第2基板110Bと対向する面）と第2基板110Bの上面（第1基板110Aと対向する面）との接続構造を介した電氣的接続を破線で模擬的に示し、第2基板110Bの下面（第3基板110Cと対向する面）と第3基板110Cの上面（第2基板110Bと対向する面）との接続構造を介した電氣的接続を実線で模擬的に示している。

[0052] 第1基板110Aの上面には、画素部206及び接続構造201の位置を示している。接続構造201は、電源信号及びGND信号等の各種の信号を外部とやり取りするための外部入出力部（I/O部）として機能する。具体的には、接続構造201は、第1基板110Aの上面に設けられるパッド151であり得る。あるいは、図1に示すように、第1基板110Aの多層配線層105、第2基板110Bの多層配線層125、又は第3基板110Cの多層配線層135内にパッド151が埋め込まれている場合には、接続構造201は、当該パッド151の外部入力との接続面を露出させるように設けられるパッド開口部153であり得る。図2Aに示すように、第1基板110Aでは、そのチップの中央に画素部206が設けられ、I/O部を構成する接続構造201は、当該画素部206の周囲に（すなわち、チップの外周に沿って）配置されている。また、図示しないが、画素信号処理回路も、当該画素部206の周囲に配置され得る。

[0053] 図2Bでは、第1基板110Aの下面における接続構造202の位置、第2基板110Bの上面における接続構造203の位置、第2基板110Bの下面における接続構造204の位置、及び第3基板110Cの上面における接続構造205の位置を概略的に示している。これら接続構造202～205は、基板間に設けられるTSV157又は電極接合構造であり得る。あるいは、第2基板110Bの多層配線層125、又は第3基板110Cの多層配線層135内にパッド151が埋め込まれている場合には、接続構造202～205のうち接続構造201の直下に位置するものは、当該パッド15

1の外部入力との接続面を露出させるように設けられるパッド開口部153であり得る。なお、図2Bでは、図2Aに示す電気的な接続を表す直線の形態に合わせて、接続構造202～205を示している。つまり、第1基板110Aの下面における接続構造202、及び第2基板110Bの上面における接続構造203については破線で示し、第2基板110Bの下面における接続構造204、及び第3基板110Cの上面における接続構造205については実線で示している。

[0054] 上述したように、図示する構成例では、画素信号処理回路が、第1基板110Aの画素部206の周囲に搭載されている。従って、第1基板110Aにおいて、画素部206で取得された画素信号は、当該画素信号処理回路においてAD変換等の処理が行われた後、第2基板110Bに伝送される。また、上述したように、第1基板110Aにおいては、I/O部を構成する接続構造201も、第1基板110Aの画素部206の周囲に配置されている。よって、図2Bに示すように、第1基板110Aの下面における接続構造202は、画素信号処理回路及びI/O部を第2基板110Bに備えられる配線と電気的に接続するために、当該画素信号処理回路及び当該I/O部が存在する領域に対応して、チップの外周に沿って配置される。また、これに対応して、第2基板110Bの上面における接続構造203も、チップの外周に沿って配置される。

[0055] 一方、第2基板110B及び第3基板110Cに搭載されるロジック回路又はメモリ回路は、チップの全面に形成され得るため、この回路が搭載される位置に対応して、図2Bに示すように、第2基板110Bの下面における接続構造204、及び第3基板110Cの上面における接続構造205は、チップの全面に渡って配置される。

[0056] 図2C及び図2Dは、固体撮像装置1における接続構造の水平面内での配置の他の例について説明するための図である。図2C及び図2Dは、例えば、固体撮像装置1が画素ADCを実行可能に構成される場合における、接続構造の配置を示している。この場合、画素信号処理回路が、第1基板110

Aではなく、第2基板110Bに搭載されることとなる。

[0057] 図2Cでは、図2Aと同様に、固体撮像装置1を構成する第1基板110A、第2基板110B、及び第3基板110Cを概略的に示している。そして、第1基板110Aの下面（第2基板110Bと対向する面）と第2基板110Bの上面（第1基板110Aと対向する面）との接続構造を介した電氣的接続を破線又は点線で模擬的に示し、第2基板110Bの下面（第3基板110Cと対向する面）と第3基板110Cの上面（第2基板110Bと対向する面）との接続構造を介した電氣的接続を実線で模擬的に示している。第1基板110Aの下面と第2基板110Bの上面との電氣的接続を示す線のうち、破線は、図2Aにおいても存在した、例えば1/O部に係る電氣的接続を示しており、点線は、図2Aにおいては存在していなかった、画素ADCに係る電氣的接続を示している。

[0058] 図2Dでは、図2Bと同様に、第1基板110Aの下面における接続構造202の位置、第2基板110Bの上面における接続構造203の位置、第2基板110Bの下面における接続構造204の位置、及び第3基板110Cの上面における接続構造205の位置を概略的に示している。なお、図2Dでは、図2Cに示す電氣的な接続を表す直線の形態に合わせて、接続構造202～205を示している。つまり、第1基板110Aの下面における接続構造202及び第2基板110Bの上面における接続構造203のうち、図2Aにおいても存在した、例えば1/O部に係る電氣的接続に対応するものについては破線で示し、画素ADCに係る電氣的接続に対応し得るものについては点線で示している。また、第2基板110Bの下面における接続構造204、及び第3基板110Cの上面における接続構造205については実線で示している。

[0059] 上述したように、図示する構成例では、画素信号処理回路が第2基板110Bに搭載されており、画素ADCが可能に構成されている。つまり、画素部206の各画素で取得された画素信号は、画素ごとに、直下の第2基板110Bに搭載される画素信号処理回路に伝送され、当該画素信号処理回路に

においてAD変換等の処理が行われる。従って、図2C及び図2Dに示すように、当該構成例では、第1基板110Aの下面における接続構造202は、I/O部からの信号を第2基板110Bに伝送するために、当該I/O部が存在する領域に対応してチップの外周に沿って配置されるとともに（図中破線で示す接続構造202）、画素部206の各画素からの画素信号を第2基板110Bに伝送するために、当該画素部206が存在する領域の全体に渡って配置されることとなる（図中点線で示す接続構造202）。

[0060] 第2基板110Bの信号線及び電源線と第3基板110Cの信号線及び電源線との電氣的な接続については、図2A及び図2Bに示す構成例と同様であるため、図2C及び図2Dに示すように、第2基板110Bの下面における接続構造204、及び第3基板110Cの上面における接続構造205は、チップの全面に渡って配置される。

[0061] 図2E及び図2Fは、固体撮像装置1における接続構造の水平面内での配置の更に他の例について説明するための図である。図2E及び図2Fは、例えば、第2基板110Bにメモリ回路が搭載される場合における、接続構造の配置を示している。

[0062] 図2Eでは、図2Aと同様に、固体撮像装置1を構成する第1基板110A、第2基板110B、及び第3基板110Cを概略的に示している。そして、第1基板110Aの下面（第2基板110Bと対向する面）と第2基板110Bの上面（第1基板110Aと対向する面）との接続構造を介した電氣的接続を破線又は点線で模擬的に示し、第2基板110Bの下面（第3基板110Cと対向する面）と第3基板110Cの上面（第2基板110Bと対向する面）との接続構造を介した電氣的接続を実線又は点線で模擬的に示している。第1基板110Aの下面と第2基板110Bの上面との電氣的接続を示す線のうち、破線は、図2Aにおいても存在した、例えばI/O部に係る電氣的接続を示しており、点線は、図2Aにおいては存在していなかったメモリ回路に係る電氣的接続を示している。また、第2基板110Bの下面と第3基板110Cの上面との電氣的接続を示す線のうち、実線は、図2

Aにおいても存在した、例えばメモリ回路の動作とは直接的には関係しない信号に係る電氣的接続を示しており、点線は、図2Aにおいては存在していなかったメモリ回路に係る電氣的接続を示している。

[0063] 図2Fでは、図2Bと同様に、第1基板110Aの下面における接続構造202の位置、第2基板110Bの上面における接続構造203の位置、第2基板110Bの下面における接続構造204の位置、及び第3基板110Cの上面における接続構造205の位置を概略的に示している。なお、図2Fでは、図2Eに示す電氣的な接続を表す直線の形態に合わせて、接続構造202～205を示している。つまり、第1基板110Aの下面における接続構造202及び第2基板110Bの上面における接続構造203のうち、図2Aにおいても存在した、例えばI/O部に係る電氣的接続に対応するものについては破線で示し、メモリ回路に係る電氣的接続に対応し得るものについては点線で示している。また、第2基板110Bの下面における接続構造204及び第3基板110Cの上面における接続構造205のうち、図2Aにおいても存在した、例えばメモリ回路の動作とは直接的には関係しない信号に係る電氣的接続に対応するものについては実線で示し、メモリ回路に係る電氣的接続に対応し得るものについては点線で示している。

[0064] 上述したように、図示する構成例では、メモリ回路が第2基板110Bに搭載されている。この場合、画素信号処理回路は第1基板110Aに搭載されており、第1基板110Aにおいて画素部206によって取得され当該画素信号処理回路によってAD変換された画素信号が、第2基板110Bのメモリ回路に伝送され、保持され得る。そして、第2基板110Bのメモリ回路に保持された画素信号を例えば外部に読み出すために、第2基板110Bのメモリ回路と第3基板110Cのロジック回路との間で信号の伝送が行われる。

[0065] 従って、当該構成例では、第1基板110Aの下面における接続構造202としては、I/O部及び画素信号処理回路からの信号を第2基板110Bに備えられる配線に伝送するために、当該I/O部及び画素信号処理回路が

搭載される領域に対応してチップの外周に沿って配置されるもの（図中破線で示す接続構造202）とともに、AD変換された画素信号を第2基板110Bのメモリ回路に伝送するためのもの（図中点線で示す接続構造202）が配置されることとなる。このとき、遅延時間を揃えるために、第1基板110Aから第2基板110Bのメモリ回路への画素信号の伝送経路の配線長、及び第2基板110Bのメモリ回路と第3基板110Cのロジック回路との間の信号の伝送経路の配線長は、それぞれ、できるだけ均等であることが望ましい。従って、例えば、図2Fに示すように、第1基板110Aと第2基板110Bのメモリ回路との間、及び第2基板110Bのメモリ回路と第3基板110Cとの間で信号をやり取りするための接続構造202～205は、水平面内の中央付近に集中的に設けられ得る。ただし、配線長を略均一にできるのであれば、接続構造202～205は、必ずしも図示する例のように水平面内の中央付近に設けられなくてもよい。

[0066] 以上、固体撮像装置1における接続構造の水平面内での配置のいくつかの例について説明した。なお、本実施形態は以上説明した例に限定されない。固体撮像装置1において各基板に搭載される構成は適宜決定されてよく、その構成に応じて、固体撮像装置1における接続構造の水平面内での配置も適宜決定されてよい。各基板に搭載される構成、及びそれに応じた接続構造の水平面内での配置としては、各種の公知のものが適用されてよい。また、図2A～図2Fに示す例では、I/O部を構成する接続構造201が、チップの外周の3辺に沿うように配置されていたが、本実施形態はかかる例に限定されない。I/O部の配置についても、各種の公知のものが適用されてよい。例えば、I/O部を構成する接続構造201は、チップの外周の1辺、2辺又は4辺に沿うように配置されてもよい。

[0067] （3. 第2基板の方向について）

図1に示す構成例では、固体撮像装置1において、第1基板110Aと第2基板110BとがFtOで貼り合わされていた（すなわち、第2基板110Bの裏面側は第1基板110Aの表面側を向いていた）。一方、固体撮

像装置 1 は、第 1 基板 110A と第 2 基板 110B とが F t o F で貼り合わされて構成されてもよい（すなわち、第 2 基板 110B の表面側は第 1 基板 110A の表面側を向いていてもよい）。

[0068] 第 2 基板 110B の方向をどちらにするかは、例えば各基板（各チップ）の構成、性能等を考慮して、固体撮像装置 1 全体としての性能が向上し得るように、適宜決定されてよい。ここでは、例として、第 2 基板 110B の方向を決定する際の 2 つの考え方について説明する。

[0069] （3-1. PWELL の面積に基づく検討）

図 3A は、図 1 に示す構成例とは異なり、第 1 基板 110A と第 2 基板 110B とが F t o F で貼り合わされた固体撮像装置 1a の概略構成を示す縦断面図である。図 3B は、図 1 に示す構成例と同様に、第 1 基板 110A と第 2 基板 110B とが F t o B で貼り合わされた固体撮像装置 1 の概略構成を示す縦断面図である。固体撮像装置 1a の構成は、第 2 基板 110B の方向が逆向きであること以外は、図 1 に示す固体撮像装置 1 と同様である。

[0070] 図 3A 及び図 3B では、多層配線層 105、125、135 に含まれる各配線の機能（信号配線、GND 配線又は電源配線）を凡例に示すハッチングによって表し、各配線の機能を表すこれらのハッチングを図 1 で示す配線のハッチングに重畳することにより表現している。図示するように、固体撮像装置 1、1a においては、信号配線、GND 配線及び電源配線を外部に引き出すための端子（上述したパッド 151 に対応する）が、チップの外周に沿って設けられている。これらの端子のそれぞれは、水平面内において画素部 206 を挟む位置に、対になって設けられる。従って、固体撮像装置 1、1a の内部においては、信号配線、GND 配線及び電源配線が、これらの端子間を接続するように延設されることとなり、水平面内に張り巡らされることとなる。

[0071] また、図 3A 及び図 3B では、第 1 基板 110A、第 2 基板 110B、及び第 3 基板 110C に設けられる PWELL に「P」を、NWELL に「N」を付している。例えば、図示する構成では、画素部の各画素に備えられる

フォトダイオードは、入射光を光電変換し、電子を取り出すために、P W E L L 中にN型拡散領域を形成したフォトダイオードとなっている。また、各画素に備えられるトランジスタは、フォトダイオードで発生した電子を読み出すために、N型M O S トランジスタとなっている。このため、当該画素部のW E L L はP W E L L である。一方、第2基板1 1 0 B及び第3基板1 1 0 Cに設けられるロジック回路及びメモリ回路については、C M O S 回路で構成されるため、P M O S 及びN M O S が混在し得る。このため、P W E L L 及びN W E L L が、例えば同程度の面積で存在している。従って、図示する構成例では、第1基板1 1 0 Aの方が、第2基板1 1 0 B及び第3基板1 1 0 Cよりも、P W E L L の面積が大きい。

[0072] ここで、固体撮像装置1、1 aにおいては、P W E L L にはG N D 電位が与えられ得る。従って、P W E L L と電源配線とが絶縁体を挟んで対向する構成が存在すると、両者の間に寄生容量が形成されることとなる。

[0073] このP W E L L と電源配線との間に形成される寄生容量について、図4 A 及び図4 Bを参照して説明する。図4 Aは、図3 Aに示す固体撮像装置1 a における、P W E L L と電源配線との間の寄生容量について説明するための図である。図4 Aでは、図3 Aに示す固体撮像装置1 aを簡略化して示し、図3 Aと同様に、図1で示す配線のハッチングに重畳されたハッチングによって各配線の機能を示す。図4 Aに示すように、固体撮像装置1 aでは、第1基板1 1 0 Aと第2基板1 1 0 BとがF t o Fで貼り合わされるため、第1基板1 1 0 Aの画素部のP W E L L と、第2基板1 1 0 Bの多層配線層1 2 5内の電源配線とが、絶縁膜1 0 3、1 2 3を構成する絶縁体を挟んで対向することとなる。従って、両者の間に寄生容量が形成され得る（図4 Aでは、当該寄生容量を、模擬的に、二点鎖線で示している）。

[0074] 一方、図4 Bは、図3 Bに示す固体撮像装置1における、P W E L L と電源配線との間の寄生容量について説明するための図である。図4 Bでは、図3 Bに示す固体撮像装置1を簡略化して示し、図3 Bと同様に、図1で示す配線のハッチングに重畳されたハッチングによって各配線の機能を示す。図

4 Bに示すように、固体撮像装置1では、第2基板110Bと第3基板110CとがF t o Fで貼り合わされるため、第3基板110Cのロジック回路又はメモリ回路のP W E L Lと、第2基板110Bの多層配線層125内の電源配線とが、絶縁膜123、133を構成する絶縁体を挟んで対向することとなる。従って、両者の間に寄生容量が形成され得る（図4 Bでは、当該寄生容量を、模擬的に、二点鎖線で示している）。

[0075] 上記寄生容量は、P W E L Lの面積が大きいほど大きくなると考えられる。従って、図4 A及び図4 Bに示す構成例であれば、図4 Aに示す第1基板110Aと第2基板110BとがF t o Fで貼り合わされる構成の方が、図4 Bに示す第2基板110Bと第3基板110CとがF t o Fで貼り合わされる構成よりも、寄生容量が大きくなる。

[0076] 第2基板110Bにおける電源配線に係る寄生容量が大きければ、当該第2基板110Bにおける電源－GNDの電流経路についてのインピーダンスが低下する。従って、当該第2基板110Bにおける電源系をより安定化することが可能になる。具体的には、例えば第2基板110Bにおける回路の動作の変動に伴って消費電力が変動した場合であっても、その消費電力の変動による電源レベルの揺らぎが抑制され得る。よって、第2基板110Bに係る回路を高速で動作させた場合であっても、その動作をより安定化させることができ、固体撮像装置1 a全体の性能の向上を図ることが可能になる。

[0077] このように、P W E L Lの面積に注目すると、図3 A～図4 Bに示す構成例では、第1基板110Aと第2基板110BとがF t o Fで貼り合わされる固体撮像装置1 aの方が、第1基板110Aと第2基板110BとがF t o Bで貼り合わされる固体撮像装置1よりも、第2基板110Bの電源配線についてより大きな寄生容量が形成され、高速動作させた際に高い安定性を得ることができる。つまり、固体撮像装置1 aの方がより好ましい構成であると言える。

[0078] ただし、各基板の設計によっては、第3基板110Cの方が第1基板110AよりもP W E L Lの面積が大きい場合もあり得る。この場合には、第2

基板 110B の電源配線と第 3 基板 110C の P W E L L との間により大きな寄生容量が形成される、固体撮像装置 1 の構成の方が、固体撮像装置 1 a よりも、高速動作させた際に高い安定性を得ることができると考えられる。

[0079] まとめると、第 2 基板 110B の方向について、P W E L L の面積に基づいて検討すると、第 1 基板 110A の P W E L L の面積が第 3 基板 110C の P W E L L の面積よりも大きい場合には、第 2 基板 110B の表面側が第 1 基板 110A の表面側を向くように、すなわち第 1 基板 110A と第 2 基板 110B とが F t o F で貼り合わされるように、固体撮像装置 1 a が構成されることが好ましい。逆に、第 3 基板 110C の P W E L L の面積が第 1 基板 110A の P W E L L の面積よりも大きい場合には、第 2 基板 110B の表面側が第 3 基板 110C の表面側を向くように、すなわち第 1 基板 110A と第 2 基板 110B とが F t o B で貼り合わされるように、固体撮像装置 1 が構成されることが好ましい。

[0080] 本実施形態では、このような P W E L L の面積に基づく観点から、第 2 基板 110B の方向が決定されてよい。図 1 及び後述する図 6 A ～図 25 E に示す本実施形態に係る固体撮像装置 1 ～25 E は、例えば、第 1 基板 110A の P W E L L の面積が第 3 基板 110C の P W E L L の面積よりも小さく構成されており、それに応じて、第 1 基板 110A と第 2 基板 110B とが F t o B で貼り合わされるように構成されている。従って、固体撮像装置 1 ～25 E によれば、高速動作時においても高い動作安定性を得ることが可能になる。

[0081] なお、第 1 基板 110A の P W E L L の面積が第 3 基板 110C の P W E L L の面積よりも大きい場合としては、例えば、第 1 基板 110A には、入射光を光電変換し、電子を取り出すフォトダイオード、及び当該フォトダイオードから電子を読み出すための N M O S トランジスタを P W E L L 中に備えた画素部のみが搭載され、第 2 基板 110B 及び第 3 基板 110C に各種の回路（画素信号処理回路、ロジック回路、及びメモリ回路等）が搭載される場合が考えられる。一方、第 3 基板 110C の P W E L L の面積が第 1 基

板 1 1 0 A の P W E L L の面積よりも大きい場合としては、例えば、第 1 基板 1 1 0 A に、画素部及び各種の回路がともに搭載され、第 1 基板 1 1 0 A における当該各種の回路が占める面積が比較的大きい場合が考えられる。

[0082] (3-2. 消費電力及び G N D 配線の配置に基づく検討)

図 3 A に示す固体撮像装置 1 a と図 3 B に示す固体撮像装置 1 について、上記では P W E L L の面積に注目したが、ここでは、各基板における消費電力と G N D 配線の配置に注目する。

[0083] 図 5 A は、図 3 A に示す固体撮像装置 1 a における、電源配線及び G N D 配線の配置を概略的に示す図である。図 5 B は、図 3 B に示す固体撮像装置 1 における、電源配線及び G N D 配線の配置を概略的に示す図である。図 5 A 及び図 5 B では、固体撮像装置 1、1 a の構造を簡易的に図示するとともに、電源配線及び G N D 配線の概略的な配置を、電源配線を二点鎖線で示し、G N D 配線を一点鎖線で示すことで表している。また、図中の矢印の大きさは、電源配線及び G N D 配線を流れる電流量を模擬的に表している。

[0084] 図 5 A 及び図 5 B に示すように、電源配線は、第 1 基板 1 1 0 A の上面（すなわち、固体撮像装置 1、1 a の上面）に設けられる電源端子（V C C）から z 軸方向に延伸する垂直電源配線 3 0 3 と、第 1 基板 1 1 0 A の多層配線層 1 0 5、第 2 基板 1 1 0 B の多層配線層 1 2 5、及び第 3 基板 1 1 0 C の多層配線層 1 3 5 内において水平方向に延伸する水平電源配線 3 0 4 と、から主に構成されるとみなすことができる。以下、垂直電源配線 3 0 3 及び水平電源配線 3 0 4 を総称して電源配線 3 0 3、3 0 4 と記載する。なお、実際には、第 1 基板 1 1 0 A の多層配線層 1 0 5 及び第 2 基板 1 1 0 B の多層配線層 1 2 5 内にも水平電源配線 3 0 4 が存在し得るが、図 5 A 及び図 5 B では、簡単のため、その図示を省略し、第 3 基板 1 1 0 C の多層配線層 1 3 5 内の水平電源配線 3 0 4 のみを図示している。

[0085] また、G N D 配線は、第 1 基板 1 1 0 A の上面に設けられる G N D 端子から z 軸方向に延伸する垂直 G N D 配線 3 0 5 と、第 1 基板 1 1 0 A の多層配線層 1 0 5、第 2 基板 1 1 0 B の多層配線層 1 2 5、及び第 3 基板 1 1 0 C

の多層配線層 1 3 5 内において水平方向に延伸する水平 GND 配線 3 0 6 と、から主に構成されるとみなすことができる。以下、垂直 GND 配線 3 0 5 及び水平 GND 配線 3 0 6 を総称して GND 配線 3 0 5、3 0 6 と記載する。なお、区別のため、第 1 基板 1 1 0 A の水平 GND 配線 3 0 6 を水平 GND 配線 3 0 6 a と記載し、第 2 基板 1 1 0 B の水平 GND 配線 3 0 6 を水平 GND 配線 3 0 6 b と記載し、第 3 基板 1 1 0 C の水平 GND 配線 3 0 6 を水平 GND 配線 3 0 6 c と記載することとする。

[0086] ここでは、一例として、第 1 基板 1 1 0 A の消費電力よりも、第 3 基板 1 1 0 C の消費電力の方が大きい場合について考える。例えば、第 3 基板 1 1 0 C は、ロジック基板であるとする。ロジック回路は、複数の回路ブロックに分かれており、処理する内容によって動作する回路ブロックも変化する。つまり、固体撮像装置 1、1 a における一連の動作中に、ロジック回路内において主に動作する場所の変動し得る。従って、ロジック回路内において電源電流が流れる場所には偏りがあり（例えば、電源電流は、回路の動作に伴うトランジスタゲート容量と配線容量の充放電に起因して発生する）、しかもその場所の変動し得る。

[0087] 今、図 5 A 及び図 5 B に示すように、第 3 基板 1 1 0 C のロジック回路内の 2 つの回路ブロック 3 0 1、3 0 2 に注目する。これら 2 つの回路ブロック 3 0 1、3 0 2 が動作する際には、電源端子－電源配線 3 0 3、3 0 4－回路ブロック 3 0 1、3 0 2－GND 配線 3 0 5、3 0 6－GND 端子の電流経路が形成される。

[0088] ここで、あるタイミングでの消費電力について、回路ブロック 3 0 1 の方が回路ブロック 3 0 2 よりも大きいとする。この場合、図 5 A 及び図 5 B に示すように、当該タイミングでは、電源配線 3 0 3、3 0 4 から、回路ブロック 3 0 1 に対して、回路ブロック 3 0 2 よりも多くの電流が供給されることとなる。この消費電力の差に起因して、回路ブロック 3 0 1、3 0 2 を介して垂直 GND 配線 3 0 5 に流れる電流量についても、回路ブロック 3 0 1 の近くの垂直 GND 配線 3 0 5（区別のため、垂直 GND 配線 3 0 5 a と

記載することとする)の方が、回路ブロック302の近くの垂直GND配線305(区別のため、垂直GND配線305bとも記載することとする)よりも大きくなる。

[0089] 第1基板110A及び第2基板110Bには、水平GND配線306a、306bが存在するから、この垂直GND配線305a、305b間における電流量の不均衡は、第1基板110Aの上面のGND端子に向かう途中で、第1基板110A及び第2基板110Bの当該水平GND配線306a、306bによって解消される。つまり、垂直GND配線305a、305b間における電流量の不均衡を解消するように、第1基板110A及び第2基板110Bの水平GND配線306a、306bに電流が流れることとなる。従って、固体撮像装置1、1aには、図5A及び図5Bにおいて実線の矢印で示すように、水平電源配線304—回路ブロック301、302—水平GND配線306c—垂直GND配線305a—水平GND配線306a、306bというループ状の電流経路が形成される。

[0090] このとき、図5Aに示すように、第1基板110Aと第2基板110BとがFt o Fで貼り合わされる固体撮像装置1aでは、第1基板110A及び第2基板110Bの水平GND配線306a、306bが、いずれも、第3基板110Cの水平電源配線304から比較的遠いところに配置されることとなる。従って、上記ループ状の電流経路において、ループの開口幅が大きくなるため、上記ループ状の電流経路のインダクタンスが大きくなる。つまり、インピーダンスが高くなる。よって、電源電流の安定性が低下し、固体撮像装置1a全体としての性能が低下してしまう恐れがある。

[0091] 一方、図5Bに示すように、第1基板110Aと第2基板110BとがFt o Bで貼り合わされる固体撮像装置1では、第1基板110Aの水平GND配線306aは、第3基板110Cの水平電源配線304から比較的遠いところに配置されるものの、第2基板110Bの水平GND配線306bは、第3基板110Cの水平電源配線304から比較的近いところに配置されることとなる。従って、上記ループ状の電流経路において、ループの開口幅

が小さくなるため、上記ループ状の電流経路のインダクタンスが小さくなる。つまり、インピーダンスが低くなる。よって、電源電流をより安定化させることができ、固体撮像装置 1 全体としての性能をより向上させることが可能となる。

[0092] このように、消費電力及び GND 配線の配置に注目すると、第 3 基板 110C の消費電力が第 1 基板 110A の消費電力よりも大きい場合には、当該第 3 基板 110C の水平電源配線 304 のより近くに第 2 基板 110B の水平 GND 配線 306b を配置させることができる、第 1 基板 110A と第 2 基板 110B とが F t o B で貼り合わされる固体撮像装置 1 の方が、第 1 基板 110A と第 2 基板 110B とが F t o F で貼り合わされる固体撮像装置 1a よりも、より安定的な動作が実現できると考えられる。つまり、固体撮像装置 1 の方がより好ましい構成であると言える。

[0093] ただし、各基板の設計によっては、第 1 基板 110A の方が第 3 基板 110C よりも消費電力が大きい場合もあり得る。この場合には、第 1 基板 110A の水平電源配線と第 2 基板 110B の水平 GND 配線 306b との距離をより近くすることができる、固体撮像装置 1a の構成の方が、固体撮像装置 1 よりも、より安定的な動作が期待できると考えられる。

[0094] まとめて、第 2 基板 110B の方向について、消費電力及び GND 配線の配置に基づいて検討すると、第 1 基板 110A の消費電力が第 3 基板 110C の消費電力よりも大きい場合には、第 2 基板 110B の表面側が第 1 基板 110A の表面側を向くように、すなわち第 1 基板 110A と第 2 基板 110B とが F t o F で貼り合わされるように、固体撮像装置 1a が構成されることが好ましい。逆に、第 3 基板 110C の消費電力が第 1 基板 110A の消費電力よりも大きい場合には、第 2 基板 110B の表面側が第 3 基板 110C の表面側を向くように、すなわち第 1 基板 110A と第 2 基板 110B とが F t o B で貼り合わされるように、固体撮像装置 1 が構成されることが好ましい。

[0095] 本実施形態では、このような消費電力及び GND 配線の配置に基づく観点

から、第2基板110Bの方向が決定されてよい。図1及び後述する図6A～図25Eに示す本実施形態に係る固体撮像装置1～25Eは、例えば、第1基板110Aの消費電力が第3基板110Cの消費電力よりも小さく構成されており、それに応じて、第1基板110Aと第2基板110BとがFt_oBで貼り合わされるように構成されている。従って、固体撮像装置1～25Eによれば、より安定的な動作が実現され得る。

[0096] なお、第3基板110Cの消費電力が第1基板110Aの消費電力よりも大きい場合としては、例えば、第1基板110Aには画素部のみが搭載され、第2基板110B及び第3基板110Cに多くの回路（例えば、画素信号処理回路、ロジック回路、及びメモリ回路等）が搭載される場合が考えられる。このような構成としては、具体的には、例えば、第1基板110Aには画素部のみが搭載され、第2基板110Bには画素信号処理回路及びメモリ回路が搭載され、第3基板110Cにロジック回路が搭載される構成等が考えられる。この際、画素信号処理回路におけるデジタル回路（例えば、AD変換のための参照電圧を生成するデジタル回路等）は、第3基板110Cに搭載されてもよい。あるいは、第3基板110Cに、アクセス頻度の高いメモリ回路（例えば、1フレームに複数回、画素信号が書き込み又は読み出しされるメモリ回路）が搭載される場合にも、当該第3基板110Cの消費電力は大きくなると考えられる。

[0097] 一方、第1基板110Aの消費電力が第3基板110Cの消費電力よりも大きい場合としては、例えば、第1基板110Aに、画素部及び各種の回路がともに搭載され、第1基板110Aにおける当該各種の回路が占める面積が比較的大きい場合が考えられる。あるいは、第3基板110Cに、アクセス頻度の低いメモリ回路（例えば、1フレームに1回だけ、画素信号が書き込み又は読み出しされるメモリ回路）が搭載される場合にも、第3基板110Cの消費電力が小さくなり、相対的に第1基板110Aの消費電力が大きくなると考えられる。

[0098] なお、第1基板110A及び第3基板110Cの消費電力を比較する際に

は、消費電力そのものが比較されてもよいし、消費電力の大小を表し得る他の指標が比較されてもよい。当該他の指標としては、例えば、各基板の回路に搭載されるゲート数（例えば、100ゲートと1Mゲート）や、各基板の回路の動作周波数（例えば、100MHzと1GHz）等が挙げられる。

[0099] ここで、図5Aに示す、第1基板110Aと第2基板110BとがFt o Fで貼り合わされる固体撮像装置1aにおいて、上記ループ状の電流経路におけるインピーダンスを低下させるための方法として、図5Cに示すように、第1基板110Aの水平GND配線306aと、第2基板110Bの水平GND配線306bとの間を、z軸方向に延伸する複数の配線（すなわち、垂直GND配線）で接続する方法が考えられる。図5Cは、図5Aに示す固体撮像装置1aにおけるインピーダンスを低下させるための一構成例を示す図である。なお、図5Cに示す固体撮像装置1bは、図5Aに示す固体撮像装置1aに対して、第1基板110Aの水平GND配線306aと、第2基板110Bの水平GND配線306bとを、複数の垂直GND配線で接続したものに对应し、その他の構成は固体撮像装置1aと同様である。

[0100] 図5Cに示す構成を採用することにより、水平GND配線306a、306bが強化され、上記ループ状の電流経路におけるインピーダンスを低下させることができるため、固体撮像装置1bは、固体撮像装置1aよりも全体としての性能をより向上させることが可能となると考えられる。なお、図5Cでは、一例として、第3基板110Cの消費電力が第1基板110Aの消費電力よりも大きく、かつ、第1基板110Aと第2基板110BとがFt o Fで貼り合わされる場合において、そのループ状の電流経路のインピーダンスを低下させ得る構成を示しているが、第1基板110Aの消費電力が第3基板110Cの消費電力よりも大きく、かつ、第1基板110Aと第2基板110BとがFt o Bで貼り合わされる場合において、そのループ状の電流経路のインピーダンスを低下させるためには、第2基板110Bの水平GND配線306bと、第3基板110Cの水平GND配線306cとの間を、複数の垂直GND配線で接続すればよい。

[0101] しかしながら、図5Cに示す構成を実現するためには、第1基板110Aの多層配線層105と、第2基板110Bの多層配線層125に、そのGND配線同士を接続するための接続構造を設ける必要がある。従って、多層配線層105、125内におけるGND配線の配置、及び他の配線の配置が、当該接続構造が設けられることを考慮した制約を受けることとなる。具体的には、図5Cに示す構成では、第1基板110A及び第2基板110Bにおいて、垂直GND配線、及びそれらを基板間で接続するための接続構造が、水平面内におけるチップの外周部だけでなく、チップの中央部にもより多く分布することとなるため、そのことを考慮して各配線を配置させる必要がある。つまり、多層配線層105、125における各配線の設計の自由度が低下する。

[0102] これに対して、上述したように、本実施形態では、第2基板110Bの向きを調整することにより、上記ループ状の電流経路のインピーダンスを低下させる。従って、図5Cに示す構成とは異なり、水平面内において、垂直GND配線がチップの外周部により多く分布するように、当該垂直GND配線を配置させることができる。よって、多層配線層105、125における各配線の設計の自由度を低下させることなく、電流経路におけるインピーダンスの低下、すなわち固体撮像装置1、1aの動作の安定化を図ることができる。

[0103] なお、水平面内のチップの外周部及びチップの中央部における垂直GND配線の配置の疎密については、例えば以下のように判断できる。例えば、チップを水平面内で3×3の領域に等分した9つの領域において、中央の1つの領域に存在する垂直GND配線の数、周囲の8つの領域に存在する垂直GND配線の数よりも多い場合には、チップの中央部における垂直GND配線の数が多いと判断できる（すなわち、図5Cに示す固体撮像装置1bの構成が適用されている可能性があると判断できる）。一方、中央の1つの領域に存在する垂直GND配線の数、周囲の8つの領域に存在する垂直GND配線の数よりも少ない場合には、チップの外周部における垂直GND配線の

数が多いと判断できる（すなわち、図5A及び図5Bに示す固体撮像装置1、1aの構成が適用されている可能性がある）と判断できる）。

[0104] ここでは一例としてチップを水平面内で9つの領域に等分した場合について説明したが、分割する領域の数はかかる例に限定されず、 4×4 の16個の領域、又は 5×5 の25個の領域等、適宜変更されてよい。例えば、チップを 4×4 の16個の領域に分割する場合には、中央の4つの領域と、その周囲の12個の領域と、における垂直GND配線の数で、粗密を判断すればよい。あるいは、チップを 5×5 の25個の領域に分割する場合には、中央の1つの領域とその周囲の24個の領域と、又は中央の9つの領域とその周囲の16個の領域と、における垂直GND配線の数で、粗密を判断すればよい。

[0105] （4．接続構造のバリエーション）

図1に示す固体撮像装置1の構成は、本実施形態に係る固体撮像装置の一例である。本実施形態に係る固体撮像装置は、図1に示すものとは異なる接続構造を有するように構成されてもよい。以下、本実施形態に係る固体撮像装置の、接続構造の異なる他の構成例について説明する。

[0106] なお、以下に説明する各固体撮像装置の構成は、図1に示す固体撮像装置1の構成の一部を変更したものに対応する。従って、図1を参照して既に説明している構成については、その詳細な説明を省略する。また、以下に説明する各固体撮像装置の概略構成を示す各図面については、図面が煩雑になることを避けるために、図1では付していた一部の符号を省略している。また、図1及び以下の各図面について、同一の種類のハッチングを付している部材は、同一の材料によって形成されていることを表す。

[0107] なお、第1の構成例～第10の構成例は、1つの半導体基板を貫通し、ツインコンタクトとして形成されたTSVによって、第1基板110Aの信号線及び電源線と第2基板110Bの信号線及び電源線とが電氣的に接続されている構成例である。また、第11の構成例～第20の構成例は、2つの半導体基板を貫通し、ツインコンタクトとして形成されたTSVによって、第

1 基板 1 1 0 A の信号線及び電源線と第 2 基板 1 1 0 B の信号線及び電源線とが電氣的に接続されている構成例である。以下では、それぞれの構成例の差分について主として説明することとする。

[0108] (4-1. 第 1 の構成例)

まず、図 6 A～図 6 G を参照して、第 1 の構成例に係る固体撮像装置 6 A～6 G について説明する。図 6 A～図 6 G は、第 1 の構成例に係る固体撮像装置 6 A～6 G の一例を示す縦断面図である。

[0109] 第 1 の構成例に係る固体撮像装置 6 A～6 G では、図 1 で示す固体撮像装置 1 と同様に、第 2 基板 1 1 0 B を貫通して設けられ、第 1 基板 1 1 0 A の多層配線層 1 0 5 内の配線を露出させる第 1 の貫通孔と、第 2 基板 1 1 0 B の多層配線層 1 2 5 内の配線を露出させる第 2 の貫通孔とに導電材料が埋め込まれたツインコンタクト構造の T S V 1 5 7 が設けられる。

[0110] 具体的には、図 6 A に示すように、T S V 1 5 7 は、第 2 基板 1 1 0 B の表面側から第 2 基板 1 1 0 B を貫通して設けられる。例えば、T S V 1 5 7 は、第 2 基板 1 1 0 B の表面側から第 2 基板 1 1 0 B を貫通し、第 1 基板 1 1 0 A の多層配線層 1 0 5 内の配線を露出させる第 1 の貫通孔と、第 2 基板 1 1 0 B の表面側から第 2 基板 1 1 0 B の多層配線層 1 2 5 内の配線を露出させる第 2 の貫通孔とに導電材料が埋め込まれた構造にて設けられる。

[0111] また、固体撮像装置 6 A では、パッド 1 5 1 は、第 1 基板 1 1 0 A の裏面側に設けられ、引き出し線開口部 1 5 5 a、1 5 5 b の内壁に成膜された導電材料層 5 1 0 によって、第 1 基板 1 1 0 A の多層配線層 1 0 5 内の配線、及び第 3 基板 1 1 0 C の多層配線層 1 3 5 内の配線と電氣的に接続する。具体的には、引き出し線開口部 1 5 5 a は、第 1 基板 1 1 0 A の裏面側から半導体基板 1 0 1 を貫通し、第 1 基板 1 1 0 A の多層配線層 1 0 5 内の配線を露出させるように形成され、引き出し線開口部 1 5 5 b は、第 1 基板 1 1 0 A の裏面側から、第 1 基板 1 1 0 A 及び第 2 基板 1 1 0 B を貫通し、第 3 基板 1 1 0 C の多層配線層 1 3 5 内の配線を露出させるように形成される。また、引き出し線開口部 1 5 5 a、1 5 5 b の内壁には、タングステン (W)

などで形成された導電材料層 510 が成膜され、導電材料層 510 は、第 1 基板 110A の裏面側の絶縁膜 109 の上まで延伸される。さらに、第 1 基板 110A の裏面側の絶縁膜 109 の上に延伸された導電材料層 510 の上には、パッド 151 が設けられる。すなわち、パッド 151 は、第 1 基板 110A の裏面上に設けられ、導電材料層 510 を介して各基板の多層配線層 105、125、135 内の配線と電氣的に接続することができる。以下では、このような構造をパッド引き出し構造とも称する。

[0112] これにより、固体撮像装置 6A では、TSV157、導電材料層 510、及びパッド 151 を介して、第 1 基板 110A、第 2 基板 110B 及び第 3 基板 110C の信号線及び電源線の各々が互いに電氣的に接続される。

[0113] また、図 6B に示すように、固体撮像装置 6A の構造に対して、パッド 151 は、絶縁膜 109 の内部に埋め込まれて形成されてもよい。

[0114] また、図 6C に示すように、TSV157 は、第 1 基板 110A の裏面側から第 1 基板 110A を貫通して設けられてもよい。具体的には、TSV157 は、第 1 基板 110A の裏面側から半導体基板 101 を貫通し、第 1 基板 110A の多層配線層 105 内の配線を露出させる第 1 の貫通孔と、第 1 基板 110A の裏面側から第 1 基板 110A を貫通し、第 2 基板 110B の多層配線層 125 内の配線を露出させる第 2 の貫通孔とに導電材料が埋め込まれた構造にて設けられてもよい。これによっても、TSV157 は、第 1 基板 110A 及び第 2 基板 110B が備える信号線及び電源線の各々を電氣的に接続することができるため、第 1 基板 110A、第 2 基板 110B 及び第 3 基板 110C の信号線及び電源線の各々は互いに電氣的に接続され得る。

[0115] また、図 6D に示すように、固体撮像装置 6C の構造に対して、パッド 151 は、第 1 基板 110A の裏面側に設けられ、引き出し線開口部 155 の内壁に成膜された導電材料層 510 によって第 3 基板 110C の多層配線層 135 内の配線と電氣的に接続してもよい。具体的には、引き出し線開口部 155 は、第 1 基板 110A の裏面側から第 1 基板 110A および第 2 基板

110Bを貫通し、第3基板110Cの多層配線層135内の配線を露出させるように形成される。また、引き出し線開口部155の内壁には、タングステン(W)などで形成された導電材料層510が成膜され、導電材料層510は、第1基板110Aの裏面側の絶縁膜109、及び第1基板110Aの裏面側に露出するTSV157の上まで延伸される。さらに、第1基板110Aの裏面側の絶縁膜109の上に延伸された導電材料層510の上には、パッド151が設けられる。これにより、パッド151は、導電材料層510を介して各基板の多層配線層105、125、135内の配線と電氣的に接続することができる。

[0116] また、図6Eに示すように、固体撮像装置6Dの構造に対して、パッド151は、絶縁膜109の内部に埋め込まれて形成されてもよい。

[0117] また、図6Fに示すように、固体撮像装置6Dの構造に対して、TSV157は、第1の貫通孔及び第2の貫通孔に導電材料が埋め込まれた構造に替えて、第1の貫通孔及び第2の貫通孔の内壁に導電材料が成膜された構造にて設けられてもよい。具体的には、TSV157の第1の貫通孔及び第2の貫通孔（すなわち、引き出し線開口部155b、155a）に導電材料層510が成膜され、導電材料層510によって、第1基板110Aの多層配線層105内の配線、及び第2基板110Bの多層配線層125内の配線は、電氣的に接続される。このような場合、TSV157は、引き出し線開口部155a、155bの内壁に成膜された導電材料層510によって、パッド151と、各基板の多層配線層内の配線とを電氣的に接続するパッド引き出し構造と類似した構造を取り得る。よって、TSV157は、パッド引き出し構造の機能を兼ねることも可能であり、引き出し線開口部155cを含むパッド引き出し構造と同時に形成することが可能である。

[0118] さらに、図6Gに示すように、固体撮像装置6Fの構造に対して、パッド151は、パッド151は、絶縁膜109の内部に埋め込まれて形成されてもよい。

[0119] なお、図6A～図6Gで示した固体撮像装置6A～6Gにおいて、導電材

料層 510 は、引き出し線開口部 155a、155b、155c ごとに電氣的に離隔されて設けられてもよい。また、パッド 151 は、引き出し線開口部 155a、155b、155c ごとに設けられていてもよく、1つの引き出し線開口部 155a、155b、155c につき複数設けられてもよい。また、TSV157 は、パッド 151 と同様の第2の金属によって形成される配線に接続してもよく、通常の配線と同様の第1の金属によって形成される配線に接続してもよい。

[0120] (4-2. 第2の構成例)

次に、図7A～図7Pを参照して、第2の構成例に係る固体撮像装置7A～7Pについて説明する。図7A～図7Pは、第2の構成例に係る固体撮像装置7A～7Pの一例を示す縦断面図である。

[0121] 第2の構成例に係る固体撮像装置7A～7Pでは、第1基板110Aの信号線及び電源線と、第2基板110Bの信号線及び電源線とを電氣的に接続するツインコンタクト構造のTSV157aに加えて、第2基板110Bの多層配線層125内の配線を露出させる第1の貫通孔と、第3基板110Cの多層配線層135内の配線を露出させる第2の貫通孔とに導電材料が埋め込まれたツインコンタクト構造のTSV157bがさらに設けられる。

[0122] 具体的には、図7Aに示すように、TSV157aは、第2基板110Bの表面側から第2基板110Bを貫通して設けられてもよい。例えば、TSV157aは、第2基板110Bの表面側から第2基板110Bを貫通し、第1基板110Aの多層配線層105内の配線を露出させる第1の貫通孔と、第2基板110Bの表面側から第2基板110Bの多層配線層125内の配線を露出させる第2の貫通孔とに導電材料が埋め込まれた構造にて設けられる。また、TSV157bは、第3基板110Cの裏面側から第3基板110Cを貫通して設けられてもよい。例えば、TSV157bは、第3基板110Cの裏面側から第3基板110Cを貫通し、第2基板110Bの多層配線層125内の配線を露出させる第1の貫通孔と、第3基板110Cの裏面側から半導体基板131を貫通し、第3基板110Cの多層配線層135

内の配線を露出させる第2の貫通孔とに導電材料が埋め込まれた構造にて設けられる。これにより、固体撮像装置7Aでは、TSV157a、157bを介して、第1基板110A、第2基板110B及び第3基板110Cの信号線及び電源線の各々が互いに電氣的に接続される。また、パッド151は、第1基板110Aの多層配線層105、第2基板110Bの多層配線層125、又は第3基板110Cの多層配線層135のいずれかの内部に設けられていればよい。

[0123] また、図7Bに示すように、パッド151は、第1基板110Aの裏面側に設けられ、引き出し線開口部155の内壁に成膜された導電材料層510によって第1基板110Aの多層配線層105内の配線と電氣的に接続してもよい。具体的には、引き出し線開口部155は、第1基板110Aの裏面側から半導体基板101を貫通し、第1基板110Aの多層配線層105内の配線を露出させるように形成される。また、引き出し線開口部155の内壁には、タングステン(W)などで形成された導電材料層510が成膜され、導電材料層510は、第1基板110Aの裏面側の絶縁膜109の上まで延伸される。さらに、第1基板110Aの裏面側の絶縁膜109の上に延伸された導電材料層510の上には、パッド151が設けられる。すなわち、パッド151は、第1基板110Aの裏面上に設けられ、導電材料層510を介して各基板の多層配線層105、125、135内の配線と電氣的に接続してもよい。

[0124] さらに、図7Cに示すように、固体撮像装置7Bの構造に対して、パッド151は、絶縁膜109の内部に埋め込まれて形成されてもよい。

[0125] また、図7Dに示すように、TSV157aは、第1基板110Aの裏面側から第1基板110Aを貫通して設けられてもよい。具体的には、TSV157aは、第1基板110Aの裏面側から半導体基板101を貫通し、第1基板110Aの多層配線層105内の配線を露出させる第1の貫通孔と、第1基板110Aの裏面側から第1基板110Aを貫通し、第2基板110Bの多層配線層125内の配線を露出させる第2の貫通孔とに導電材料が埋

め込まれた構造にて設けられてもよい。これによっても、TSV157aは、第1基板110Aの配線及び第2基板110Bの配線を電氣的に接続することができるため、第1基板110A、第2基板110B及び第3基板110Cの信号線及び電源線の各々は互いに電氣的に接続され得る。

[0126] さらに、図7Eに示すように、固体撮像装置7Dの構造に対して、第1基板110Aの裏面側には導電材料層510が設けられ、導電材料層510の上にはパッド151が設けられてもよい。導電材料層510が第1基板110Aの裏面側に露出したTSV157aの上に延伸されるように設けられることで、外部回路との接点となるパッド151は、TSV157a、157bを介して、第1基板110A、第2基板110B及び第3基板110Cの信号線及び電源線の各々と互いに電氣的に接続することができる。

[0127] さらに、図7Fに示すように、固体撮像装置7Eの構造に対して、パッド151は、絶縁膜109の内部に埋め込まれて形成されてもよい。

[0128] また、図7Gに示すように、固体撮像装置7Eの構造に対して、TSV157aは、第1の貫通孔及び第2の貫通孔に導電材料が埋め込まれた構造に替えて、第1の貫通孔及び第2の貫通孔の内壁に導電材料が成膜された構造にて設けられてもよい。具体的には、TSV157aの第1の貫通孔及び第2の貫通孔（すなわち、引き出し線開口部155b、155a）に導電材料層510が成膜され、導電材料層510によって、第1基板110Aの多層配線層105内の配線、及び第2基板110Bの多層配線層125内の配線は、電氣的に接続される。このような場合、TSV157aは、引き出し線開口部155a、155bの内壁に成膜された導電材料層510によって、パッド151と、各基板の多層配線層内の配線とを電氣的に接続するパッド引き出し構造と類似した構造を取り得る。よって、TSV157aは、パッド引き出し構造の機能を兼ねることも可能である。

[0129] さらに、図7Hに示すように、固体撮像装置7Gの構造に対して、パッド151は、絶縁膜109の内部に埋め込まれて形成されてもよい。

[0130] また、図7Iに示すように、TSV157bは、第2基板110Bの裏面

側から第2基板110Bを貫通して設けられてもよい。具体的には、TSV157bは、第2基板110Bの裏面側から半導体基板121を貫通し、第2基板110Bの多層配線層125内の配線を露出させる第1の貫通孔と、第2基板110Bの裏面側から第2基板110Bを貫通し、第3基板110Cの多層配線層135内の配線を露出させる第2の貫通孔とに導電材料が埋め込まれた構造にて設けられてもよい。これによっても、TSV157bは、第2基板110Bの配線及び第3基板110Cの配線を電氣的に接続することができるため、第1基板110A、第2基板110B及び第3基板110Cの信号線及び電源線の各々は互いに電氣的に接続され得る。

[0131] また、図7Jに示すように、固体撮像装置7Iの構造に対して、パッド151は、第1基板110Aの裏面側に設けられ、引き出し線開口部155の内壁に成膜された導電材料層510によって第1基板110Aの多層配線層105内の配線と電氣的に接続してもよい。具体的には、引き出し線開口部155は、第1基板110Aの裏面側から半導体基板101を貫通し、第1基板110Aの多層配線層105内の配線を露出させるように形成される。また、引き出し線開口部155の内壁には、タングステン(W)などで形成された導電材料層510が成膜され、導電材料層510は、第1基板110Aの裏面側の絶縁膜109の上まで延伸される。さらに、第1基板110Aの裏面側の絶縁膜109の上に延伸された導電材料層510の上には、パッド151が設けられる。これにより、パッド151は、導電材料層510を介して第1基板110Aの多層配線層105内の配線と電氣的に接続することができる。

[0132] さらに、図7Kに示すように、固体撮像装置7Jの構造に対して、パッド151は、絶縁膜109の内部に埋め込まれて形成されてもよい。

[0133] また、図7Lに示すように、固体撮像装置7Iの構造に対して、TSV157aは、第1基板110Aの裏面側から第1基板110Aを貫通して設けられてもよい。具体的には、TSV157aは、第1基板110Aの裏面側から半導体基板101を貫通し、第1基板110Aの多層配線層105内の

配線を露出させる第1の貫通孔と、第1基板110Aの裏面側から第1基板110Aを貫通し、第2基板110Bの多層配線層125内の配線を露出させる第2の貫通孔とに導電材料が埋め込まれた構造にて設けられてもよい。これによっても、TSV157aは、第1基板110Aの配線及び第2基板110Bの配線を電氣的に接続することができるため、第1基板110A、第2基板110B及び第3基板110Cの信号線及び電源線の各々は互いに電氣的に接続され得る。

[0134] さらに、図7Mに示すように、固体撮像装置7Lの構造に対して、第1基板110Aの裏面側には導電材料層510が設けられ、導電材料層510の上にはパッド151が設けられてもよい。導電材料層510が第1基板110Aの裏面側に露出したTSV157aの上に延伸されるように設けられることで、外部回路との接点となるパッド151は、TSV157a、157bを介して、第1基板110A、第2基板110B及び第3基板110Cの信号線及び電源線の各々と互いに電氣的に接続することができる。

[0135] さらに、図7Nに示すように、固体撮像装置7Mの構造に対して、パッド151は、絶縁膜109の内部に埋め込まれて形成されてもよい。

[0136] また、図7Oに示すように、固体撮像装置7Mの構造に対して、TSV157aは、第1の貫通孔及び第2の貫通孔に導電材料が埋め込まれた構造に替えて、第1の貫通孔及び第2の貫通孔の内壁に導電材料が成膜された構造にて設けられてもよい。具体的には、TSV157aの第1の貫通孔及び第2の貫通孔（すなわち、引き出し線開口部155b、155a）に導電材料層510が成膜され、導電材料層510によって、第1基板110Aの多層配線層105内の配線、及び第2基板110Bの多層配線層125内の配線は、電氣的に接続される。このような場合、TSV157aは、引き出し線開口部155a、155bの内壁に成膜された導電材料層510によって、パッド151と、各基板の多層配線層内の配線とを電氣的に接続するパッド引き出し構造と類似した構造を取り得る。よって、TSV157aは、パッド引き出し構造の機能を兼ねることも可能である。

[0137] さらに、図 7 P に示すように、固体撮像装置 7 O の構造に対して、パッド 1 5 1 は、絶縁膜 1 0 9 の内部に埋め込まれて形成されてもよい。

[0138] なお、図 7 A ～図 7 P で示した固体撮像装置 7 A ～7 P において、導電材料層 5 1 0 は、引き出し線開口部 1 5 5 a、1 5 5 b ごとに電氣的に離隔されて設けられてもよい。また、パッド 1 5 1 は、引き出し線開口部 1 5 5 a、1 5 5 b ごとに設けられていてもよく、1 つの引き出し線開口部 1 5 5 a、1 5 5 b につき複数設けられてもよい。また、TSV 1 5 7 は、パッド 1 5 1 と同様の第 2 の金属によって形成される配線に接続してもよく、通常の配線と同様の第 1 の金属によって形成される配線に接続してもよい。

[0139] (4-3. 第 3 の構成例)

続いて、図 8 A ～図 8 J を参照して、第 3 の構成例に係る固体撮像装置 8 A ～8 J について説明する。図 8 A ～図 8 J は、第 3 の構成例に係る固体撮像装置 8 A ～8 J の一例を示す縦断面図である。

[0140] 第 3 の構成例に係る固体撮像装置 8 A ～8 J では、第 1 基板 1 1 0 A の信号線及び電源線と、第 2 基板 1 1 0 B の信号線及び電源線とを電氣的に接続するツインコンタクト構造の TSV 1 5 7 a に加えて、第 1 基板 1 1 0 A の裏面側から第 2 基板 1 1 0 B の多層配線層 1 2 5 内の配線を露出させる第 1 の貫通孔と、第 1 基板 1 1 0 A の裏面側から第 3 基板 1 1 0 C の多層配線層 1 3 5 内の配線を露出させる第 2 の貫通孔とに導電材料が埋め込まれたツインコンタクト構造の TSV 1 5 7 b がさらに設けられる。

[0141] 具体的には、図 8 A に示すように、TSV 1 5 7 a は、第 2 基板 1 1 0 B の表面側から第 2 基板 1 1 0 B を貫通し、第 1 基板 1 1 0 A の多層配線層 1 0 5 内の配線を露出させる第 1 の貫通孔と、第 2 基板 1 1 0 B の表面側から第 2 基板 1 1 0 B の多層配線層 1 2 5 内の配線を露出させる第 2 の貫通孔とに導電材料が埋め込まれた構造にて設けられる。また、TSV 1 5 7 b は、第 1 基板 1 1 0 A の裏面側から第 1 基板 1 1 0 A を貫通し、第 2 基板 1 1 0 B の多層配線層 1 2 5 内の配線を露出させる第 1 の貫通孔と、第 1 基板 1 1 0 A の裏面側から第 1 基板 1 1 0 A 及び第 2 基板 1 1 0 B を貫通し、第 3 基

板 1 1 0 C の多層配線層 1 3 5 内の配線を露出させる第 2 の貫通孔とに導電材料が埋め込まれた構造にて設けられる。これにより、固体撮像装置 8 A では、T S V 1 5 7 a、1 5 7 b を介して、第 1 基板 1 1 0 A、第 2 基板 1 1 0 B 及び第 3 基板 1 1 0 C の信号線及び電源線の各々が互いに電氣的に接続される。また、パッド 1 5 1 は、第 1 基板 1 1 0 A の多層配線層 1 0 5、第 2 基板 1 1 0 B の多層配線層 1 2 5、又は第 3 基板 1 1 0 C の多層配線層 1 3 5 のいずれかの内部に設けられていればよい。

[0142] また、図 8 B に示すように、固体撮像装置 8 A の構造に対して、第 1 基板 1 1 0 A の裏面側には導電材料層 5 1 0 が設けられ、導電材料層 5 1 0 の上にはパッド 1 5 1 が設けられてもよい。導電材料層 5 1 0 が第 1 基板 1 1 0 A の裏面側に露出した T S V 1 5 7 b の上に延伸されるように設けられることで、外部回路との接点となるパッド 1 5 1 は、T S V 1 5 7 a、1 5 7 b を介して、第 1 基板 1 1 0 A、第 2 基板 1 1 0 B 及び第 3 基板 1 1 0 C の各配線と互いに電氣的に接続することができる。

[0143] さらに、図 8 C に示すように、固体撮像装置 8 B の構造に対して、パッド 1 5 1 は、絶縁膜 1 0 9 の内部に埋め込まれて形成されてもよい。

[0144] また、図 8 D に示すように、固体撮像装置 8 A の構造に対して、T S V 1 5 7 b は、第 1 の貫通孔及び第 2 の貫通孔に導電材料が埋め込まれた構造に替えて、第 1 の貫通孔及び第 2 の貫通孔の内壁に導電材料が成膜された構造にて設けられてもよい。具体的には、T S V 1 5 7 b の第 1 の貫通孔及び第 2 の貫通孔（すなわち、引き出し線開口部 1 5 5 a、1 5 5 b）に導電材料層 5 1 0 が成膜され、導電材料層 5 1 0 によって、第 1 基板 1 1 0 A の多層配線層 1 0 5 内の配線、及び第 2 基板 1 1 0 B の多層配線層 1 2 5 内の配線は、電氣的に接続される。このような場合、T S V 1 5 7 b は、引き出し線開口部 1 5 5 a、1 5 5 b の内壁に成膜された導電材料層 5 1 0 によって、パッド 1 5 1 と、各基板の多層配線層内の配線とを電氣的に接続するパッド引き出し構造と類似した構造を取り得る。よって、T S V 1 5 7 b は、パッド引き出し構造の機能を兼ねることも可能である。

[0145] さらに、図 8 E に示すように、固体撮像装置 8 D の構造に対して、パッド 1 5 1 は、絶縁膜 1 0 9 の内部に埋め込まれて形成されてもよい。

[0146] また、図 8 F に示すように、固体撮像装置 8 A の構造に対して、T S V 1 5 7 a は、第 1 基板 1 1 0 A の裏面側から第 1 基板 1 1 0 A を貫通して設けられてもよい。具体的には、T S V 1 5 7 a は、第 1 基板 1 1 0 A の裏面側から半導体基板 1 0 1 を貫通し、第 1 基板 1 1 0 A の多層配線層 1 0 5 内の配線を露出させる第 1 の貫通孔と、第 1 基板 1 1 0 A を貫通し、第 2 基板 1 1 0 B の多層配線層 1 2 5 内の配線を露出させる第 2 の貫通孔とに導電材料が埋め込まれた構造にて設けられてもよい。これによっても、T S V 1 5 7 a は、第 1 基板 1 1 0 A の配線及び第 2 基板 1 1 0 B の配線を電氣的に接続することができるため、第 1 基板 1 1 0 A、第 2 基板 1 1 0 B 及び第 3 基板 1 1 0 C の信号線及び電源線の各々は互いに電氣的に接続され得る。なお、T S V 1 5 7 a 及び T S V 1 5 7 b を構成する貫通孔は、第 2 基板 1 1 0 B の多層配線層 1 2 5 内の同じ配線を露出させてもよく、互いに第 2 基板 1 1 0 B の多層配線層 1 2 5 内の異なる配線を露出させてもよい。

[0147] さらに、図 8 G に示すように、固体撮像装置 8 F の構造に対して、第 1 基板 1 1 0 A の裏面側には導電材料層 5 1 0 が設けられ、導電材料層 5 1 0 の上にはパッド 1 5 1 が設けられてもよい。導電材料層 5 1 0 が第 1 基板 1 1 0 A の裏面側に露出した T S V 1 5 7 a、1 5 7 b の上に延伸されるように設けられることで、外部回路との接点となるパッド 1 5 1 は、T S V 1 5 7 a、1 5 7 b を介して、第 1 基板 1 1 0 A、第 2 基板 1 1 0 B 及び第 3 基板 1 1 0 C の信号線及び電源線の各々と互いに電氣的に接続することができる。

[0148] さらに、図 8 H に示すように、固体撮像装置 8 G の構造に対して、パッド 1 5 1 は、絶縁膜 1 0 9 の内部に埋め込まれて形成されてもよい。

[0149] また、図 8 I に示すように固体撮像装置 8 G の構造に対して、T S V 1 5 7 a、1 5 7 b は、第 1 の貫通孔及び第 2 の貫通孔の各々に導電材料が埋め込まれた構造に替えて、第 1 の貫通孔及び第 2 の貫通孔の各々の内壁に導電

材料が成膜された構造にて設けられてもよい。具体的には、TSV157aの第1の貫通孔及び第2の貫通孔（すなわち、引き出し線開口部155b、155a）に導電材料層510が成膜され、導電材料層510によって、第1基板110Aの多層配線層105内の配線、及び第2基板110Bの多層配線層125内の配線は、電氣的に接続される。また、TSV157bの第1の貫通孔及び第2の貫通孔（すなわち、引き出し線開口部155c、155d）に導電材料層510が成膜され、導電材料層510によって、第2基板110Bの多層配線層125内の配線、及び第3基板110Cの多層配線層135内の配線は、電氣的に接続される。このような場合、TSV157a、157bは、引き出し線開口部155a、155b、155c、155dの内壁に成膜された導電材料層510によって、パッド151と、各基板の多層配線層内の配線とを電氣的に接続するパッド引き出し構造と類似した構造を取り得る。よって、TSV157a、157bは、パッド引き出し構造の機能を兼ねることも可能である。

[0150] さらに、図8Jに示すように、固体撮像装置8Iの構造に対して、パッド151は、絶縁膜109の内部に埋め込まれて形成されてもよい。

[0151] なお、図8A～図8Jで示した固体撮像装置8A～8Jにおいて、導電材料層510は、引き出し線開口部155a、155b、155c、155dごとに電氣的に離隔されて設けられてもよい。また、パッド151は、引き出し線開口部155a、155b、155c、155dごとに設けられていてもよく、1つの引き出し線開口部155a、155b、155c、155dにつき複数設けられてもよい。また、TSV157a、157bは、パッド151と同様の第2の金属によって形成される配線に接続してもよく、通常の配線と同様の第1の金属によって形成される配線に接続してもよい。

[0152] （4-4. 第4の構成例）

次に、図9A～図9Hを参照して、第4の構成例に係る固体撮像装置9A～9Hについて説明する。図9A～図9Hは、第4の構成例に係る固体撮像装置9A～9Hの一例を示す縦断面図である。

[0153] 第4の構成例に係る固体撮像装置9A～9Hでは、第1基板110Aの信号線及び電源線と、第2基板110Bの信号線及び電源線とを電氣的に接続するツインコンタクト構造のTSV157aに加えて、第2基板110Bの多層配線層125内の配線、及び第3基板110Cの多層配線層135内の配線と接続し、1つの貫通孔に導電材料が埋め込まれたシェアドコンタクト構造のTSV157bがさらに設けられる。

[0154] 具体的には、図9Aに示すように、TSV157aは、第2基板110Bの表面側から第2基板110Bを貫通して設けられる。例えば、TSV157aは、第2基板110Bの表面側から第2基板110Bを貫通し、第1基板110Aの多層配線層105内の配線を露出させる第1の貫通孔と、第2基板110Bの表面側から第2基板110Bの多層配線層125内の配線を露出させる第2の貫通孔とに導電材料が埋め込まれた構造にて設けられる。TSV157bは、第3基板110Cの裏面側から第3基板110Cを貫通して設けられ、第3基板110Cの多層配線層135内の配線と接触して第2基板110Bの多層配線層125内の配線を露出させる1つの貫通孔に導電材料が埋め込まれた構造にて設けられる。これにより、固体撮像装置9Aでは、TSV157a、157bを介して、第1基板110A、第2基板110B及び第3基板110Cの信号線及び電源線の各々が互いに電氣的に接続される。また、パッド151は、第1基板110Aの多層配線層105、第2基板110Bの多層配線層125、又は第3基板110Cの多層配線層135のいずれかの内部に設けられていればよい。

[0155] また、図9Bに示すように、パッド151は、第1基板110Aの裏面側に設けられ、引き出し線開口部155の内壁に成膜された導電材料層510によって第1基板110Aの多層配線層105内の配線と電氣的に接続してもよい。具体的には、引き出し線開口部155は、第1基板110Aの裏面側から半導体基板101を貫通し、第1基板110Aの多層配線層105内の配線を露出させるように形成される。また、引き出し線開口部155の内壁には、タングステン(W)などで形成された導電材料層510が成膜され

、導電材料層 510 は、第 1 基板 110A の裏面側の絶縁膜 109 の上まで延伸される。さらに、第 1 基板 110A の裏面側の絶縁膜 109 の上に延伸された導電材料層 510 の上には、パッド 151 が設けられる。すなわち、パッド 151 は、第 1 基板 110A の裏面上に設けられ、導電材料層 510 を介して各基板の多層配線層 105、125、135 内の配線と電氣的に接続してもよい。

[0156] さらに、図 9C に示すように、固体撮像装置 9B の構造に対して、パッド 151 は、絶縁膜 109 の内部に埋め込まれて形成されてもよい。

[0157] また、図 9D に示すように、TSV 157b は、第 2 基板 110B の裏面側から第 2 基板 110B を貫通して設けられてもよい。具体的には、TSV 157b は、第 2 基板 110B の裏面側から第 2 基板 110B を貫通し、第 2 基板 110B の多層配線層 125 内の配線と接触して第 3 基板 110C の多層配線層 135 内の配線を露出させる 1 つの貫通孔に導電材料が埋め込まれた構造にて設けられてもよい。これによっても、TSV 157b は、第 2 基板 110B の配線及び第 3 基板 110C の配線を電氣的に接続することができるため、第 1 基板 110A、第 2 基板 110B 及び第 3 基板 110C の信号線及び電源線の各々は互いに電氣的に接続され得る。

[0158] さらに、図 9E に示すように、固体撮像装置 9D の構造に対して、第 1 基板 110A の裏面側には導電材料層 510 が設けられ、導電材料層 510 の上にはパッド 151 が設けられてもよい。導電材料層 510 が第 1 基板 110A の裏面側に露出した TSV 157a の上に延伸されるように設けられることで、外部回路との接点となるパッド 151 は、TSV 157a、157b を介して、第 1 基板 110A、第 2 基板 110B 及び第 3 基板 110C の信号線及び電源線の各々と互いに電氣的に接続することができる。

[0159] さらに、図 9F に示すように、固体撮像装置 9E の構造に対して、パッド 151 は、絶縁膜 109 の内部に埋め込まれて形成されてもよい。

[0160] また、図 9G に示すように、固体撮像装置 9E の構造に対して、TSV 157a は、第 1 の貫通孔及び第 2 の貫通孔に導電材料が埋め込まれた構造に

替えて、第1の貫通孔及び第2の貫通孔の内壁に導電材料が成膜された構造にて設けられてもよい。具体的には、TSV157aの第1の貫通孔及び第2の貫通孔（すなわち、引き出し線開口部155b、155a）に導電材料層510が成膜され、導電材料層510によって、第1基板110Aの多層配線層105内の配線、及び第2基板110Bの多層配線層125内の配線は、電氣的に接続される。このような場合、TSV157aは、引き出し線開口部155a、155bの内壁に成膜された導電材料層510によって、パッド151と、各基板の多層配線層内の配線とを電氣的に接続するパッド引き出し構造と類似した構造を取り得る。よって、TSV157aは、パッド引き出し構造の機能を兼ねることも可能である。

[0161] さらに、図9Hに示すように、固体撮像装置9Gの構造に対して、パッド151は、絶縁膜109の内部に埋め込まれて形成されてもよい。

[0162] なお、図9A～図9Hで示した固体撮像装置9A～9Hにおいて、導電材料層510は、引き出し線開口部155a、155bごとに電氣的に離隔されて設けられてもよい。また、パッド151は、引き出し線開口部155a、155bごとに設けられていてもよく、1つの引き出し線開口部155a、155bにつき複数設けられてもよい。また、TSV157a、157bは、パッド151と同様の第2の金属によって形成される配線に接続してもよく、通常の配線と同様の第1の金属によって形成される配線に接続してもよい。

[0163] （4－5．第5の構成例）

続いて、図10A～図10Jを参照して、第5の構成例に係る固体撮像装置10A～10Jについて説明する。図10A～図10Jは、第5の構成例に係る固体撮像装置10A～10Jの一例を示す縦断面図である。

[0164] 第5の構成例に係る固体撮像装置10A～10Jでは、第1基板110Aの信号線及び電源線と、第2基板110Bの信号線及び電源線とを電氣的に接続するツインコンタクト構造のTSV157aに加えて、第1基板110Aの裏面側から第1基板110A及び第2基板110Bを貫通して設けられ

た1つの貫通孔に導電材料が埋め込まれたシェアドコンタクト構造のTSV157bがさらに設けられる。

[0165] 具体的には、図10Aに示すように、TSV157aは、第2基板110Bの表面側から第2基板110Bを貫通して設けられる。例えば、TSV157aは、第2基板110Bの表面側から第2基板110Bを貫通し、第1基板110Aの多層配線層105内の配線を露出させる第1の貫通孔と、第2基板110Bの表面側から第2基板110Bの多層配線層125内の配線を露出させる第2の貫通孔とに導電材料が埋め込まれた構造にて設けられる。また、TSV157bは、第1基板110Aの裏面側から第1基板110A及び第2基板110Bを貫通して設けられ、第2基板110Bの多層配線層125内の配線と接触して、第3基板110Cの多層配線層135内の配線を露出させる1つの貫通孔に導電材料が埋め込まれた構造にて設けられる。これにより、固体撮像装置10Aでは、TSV157a、157bを介して、第1基板110A、第2基板110B及び第3基板110Cの信号線及び電源線の各々が互いに電氣的に接続される。また、パッド151は、第1基板110Aの多層配線層105、第2基板110Bの多層配線層125、又は第3基板110Cの多層配線層135のいずれかの内部に設けられていればよい。

[0166] また、図10Bに示すように、固体撮像装置10Aの構造に対して、第1基板110Aの裏面側には導電材料層510が設けられ、導電材料層510の上にはパッド151が設けられてもよい。導電材料層510が第1基板110Aの裏面側に露出したTSV157bの上に延伸されるように設けられることで、外部回路との接点となるパッド151は、TSV157a、157bを介して、第1基板110A、第2基板110B及び第3基板110Cの信号線及び電源線の各々と互いに電氣的に接続することができる。

[0167] さらに、図10Cに示すように、固体撮像装置10Bの構造に対して、パッド151は、絶縁膜109の内部に埋め込まれて形成されてもよい。

[0168] また、図10Dに示すように、固体撮像装置10Bの構造に対して、TS

V 1 5 7 b は、貫通孔に導電材料が埋め込まれた構造に替えて、貫通孔の内壁に導電材料が成膜された構造にて設けられてもよい。具体的には、T S V 1 5 7 b の貫通孔（すなわち、引き出し線開口部 1 5 5）に導電材料層 5 1 0 が成膜され、導電材料層 5 1 0 によって、第 2 基板 1 1 0 B の多層配線層 1 2 5 内の配線、及び第 3 基板 1 1 0 C の多層配線層 1 3 5 内の配線は、電氣的に接続される。このような場合、T S V 1 5 7 b は、引き出し線開口部 1 5 5 の内壁に成膜された導電材料層 5 1 0 によって、パッド 1 5 1 と、各基板の多層配線層内の配線とを電氣的に接続するパッド引き出し構造と類似した構造を取り得る。よって、T S V 1 5 7 b は、パッド引き出し構造の機能を兼ねることも可能である。

[0169] さらに、図 1 0 E に示すように、固体撮像装置 1 0 D の構造に対して、パッド 1 5 1 は、絶縁膜 1 0 9 の内部に埋め込まれて形成されてもよい。

[0170] また、図 1 0 F に示すように、固体撮像装置 1 0 A の構造に対して、T S V 1 5 7 a は、第 1 基板 1 1 0 A の裏面側から第 1 基板 1 1 0 A を貫通して設けられてもよい。具体的には、T S V 1 5 7 a は、第 1 基板 1 1 0 A の裏面側から半導体基板 1 0 1 を貫通し、第 1 基板 1 1 0 A の多層配線層 1 0 5 内の配線を露出させる第 1 の貫通孔と、第 1 基板 1 1 0 A の裏面側から第 1 基板 1 1 0 A を貫通し、第 2 基板 1 1 0 B の多層配線層 1 2 5 内の配線を露出させる第 2 の貫通孔とに導電材料が埋め込まれた構造にて設けられてもよい。これによっても、T S V 1 5 7 a は、第 1 基板 1 1 0 A の配線及び第 2 基板 1 1 0 B の配線を電氣的に接続することができるため、第 1 基板 1 1 0 A、第 2 基板 1 1 0 B 及び第 3 基板 1 1 0 C の信号線及び電源線の各々は互いに電氣的に接続され得る。なお、T S V 1 5 7 a 及び T S V 1 5 7 b が接続する第 2 基板 1 1 0 B の多層配線層 1 2 5 内の配線は、同じであってもよく、互いに異なってもよい。

[0171] さらに、図 1 0 G に示すように、固体撮像装置 1 0 F の構造に対して、第 1 基板 1 1 0 A の裏面側には導電材料層 5 1 0 が設けられ、導電材料層 5 1 0 の上にはパッド 1 5 1 が設けられてもよい。導電材料層 5 1 0 が第 1 基板

110Aの裏面側に露出したTSV157a、157bの上に延伸されるように設けられることで、外部回路との接点となるパッド151は、TSV157a、157bを介して、第1基板110A、第2基板110B及び第3基板110Cの信号線及び電源線の各々と互いに電氣的に接続することができる。

[0172] さらに、図10Hに示すように、固体撮像装置10Gの構造に対して、パッド151は、絶縁膜109の内部に埋め込まれて形成されてもよい。

[0173] また、図10Iに示すように固体撮像装置10Gの構造に対して、TSV157a、157bは、各々の貫通孔に導電材料が埋め込まれた構造に替えて、各々の貫通孔の内壁に導電材料が成膜された構造にて設けられてもよい。具体的には、TSV157aの第1の貫通孔及び第2の貫通孔（すなわち、引き出し線開口部155b、155a）に導電材料層510が成膜され、導電材料層510によって、第1基板110Aの多層配線層105内の配線、及び第2基板110Bの多層配線層125内の配線は、電氣的に接続される。また、TSV157bの貫通孔（すなわち、引き出し線開口部155c）に導電材料層510が成膜され、導電材料層510によって、第2基板110Bの多層配線層125内の配線、及び第3基板110Cの多層配線層135内の配線は、電氣的に接続される。このような場合、TSV157a、157bは、引き出し線開口部155a、155b、155cの内壁に成膜された導電材料層510によって、パッド151と、各基板の多層配線層内の配線とを電氣的に接続するパッド引き出し構造と類似した構造を取り得る。よって、TSV157a、157bは、パッド引き出し構造の機能を兼ねることも可能である。

[0174] さらに、図10Jに示すように、固体撮像装置10Iの構造に対して、パッド151は、絶縁膜109の内部に埋め込まれて形成されてもよい。

[0175] なお、図10A～図10Jで示した固体撮像装置10A～10Jにおいて、導電材料層510は、引き出し線開口部155a、155b、155cごとに電氣的に離隔されて設けられてもよい。また、パッド151は、引き出

し線開口部 155a、155b、155c ごとに設けられていてもよく、1 つの引き出し線開口部 155a、155b、155c につき複数設けられてもよい。また、TSV157a、157b は、パッド 151 と同様の第 2 の金属によって形成される配線に接続してもよく、通常の配線と同様の第 1 の金属によって形成される配線に接続してもよい。

[0176] (4-6. 第 6 の構成例)

次に、図 11A~図 11H を参照して、第 6 の構成例に係る固体撮像装置 11A~11H について説明する。図 11A~図 11H は、第 6 の構成例に係る固体撮像装置 11A~11H の一例を示す縦断面図である。

[0177] 第 6 の構成例に係る固体撮像装置 11A~11H では、第 1 基板 110A の信号線及び電源線と、第 2 基板 110B の信号線及び電源線とを電氣的に接続するツインコンタクト構造の TSV157a に加えて、第 2 基板 110B 及び第 3 基板 110C の貼り合わせ面に、互いの電極が直接接触する状態で接合された電極接合構造 159 がさらに設けられる。

[0178] 具体的には、図 11A に示すように、電極接合構造 159 は、第 2 基板 110B の多層配線層 125 の最上層に形成された電極と、第 3 基板 110C の多層配線層 135 の最上層に形成された電極とが直接接触した状態で接合されることで、形成される。また、TSV157 は、第 2 基板 110B の表面側から第 2 基板 110B を貫通して設けられる。例えば、TSV157 は、第 2 基板 110B の表面側から第 2 基板 110B を貫通し、第 1 基板 110A の多層配線層 105 内の配線を露出させる第 1 の貫通孔と、第 2 基板 110B の表面側から第 2 基板 110B の多層配線層 125 内の配線を露出させる第 2 の貫通孔とに導電材料が埋め込まれた構造にて設けられる。これにより、固体撮像装置 11A では、TSV157 及び電極接合構造 159 を介して、第 1 基板 110A、第 2 基板 110B 及び第 3 基板 110C の信号線及び電源線の各々が互いに電氣的に接続される。また、パッド 151 は、第 1 基板 110A の多層配線層 105、第 2 基板 110B の多層配線層 125、又は第 3 基板 110C の多層配線層 135 のいずれかの内部に設けられてい

ればよい。

[0179] また、図 1 1 B に示すように、パッド 1 5 1 は、第 1 基板 1 1 0 A の裏面側に設けられ、引き出し線開口部 1 5 5 の内壁に成膜された導電材料層 5 1 0 によって第 1 基板 1 1 0 A の多層配線層 1 0 5 内の配線と電氣的に接続してもよい。具体的には、引き出し線開口部 1 5 5 は、第 1 基板 1 1 0 A の裏面側から半導体基板 1 0 1 を貫通し、第 1 基板 1 1 0 A の多層配線層 1 0 5 内の配線を露出させるように形成される。また、引き出し線開口部 1 5 5 の内壁には、タングステン (W) などで形成された導電材料層 5 1 0 が成膜され、導電材料層 5 1 0 は、第 1 基板 1 1 0 A の裏面側の絶縁膜 1 0 9 の上まで延伸される。さらに、第 1 基板 1 1 0 A の裏面側の絶縁膜 1 0 9 の上に延伸された導電材料層 5 1 0 の上には、パッド 1 5 1 が設けられる。すなわち、パッド 1 5 1 は、第 1 基板 1 1 0 A の裏面上に設けられ、導電材料層 5 1 0 を介して各基板の多層配線層 1 0 5、1 2 5、1 3 5 内の配線と電氣的に接続してもよい。

[0180] さらに、図 1 1 C に示すように、固体撮像装置 1 1 B の構造に対して、パッド 1 5 1 は、絶縁膜 1 0 9 の内部に埋め込まれて形成されてもよい。

[0181] また、図 1 1 D に示すように、TSV 1 5 7 は、第 1 基板 1 1 0 A の裏面側から第 1 基板 1 1 0 A を貫通して設けられてもよい。具体的には、TSV 1 5 7 は、第 1 基板 1 1 0 A の裏面側から半導体基板 1 0 1 を貫通し、第 1 基板 1 1 0 A の多層配線層 1 0 5 内の配線を露出させる第 1 の貫通孔と、第 1 基板 1 1 0 A を貫通し、第 2 基板 1 1 0 B の多層配線層 1 2 5 内の配線を露出させる第 2 の貫通孔とに導電材料が埋め込まれた構造にて設けられてもよい。これによっても、TSV 1 5 7 は、第 1 基板 1 1 0 A の配線及び第 2 基板 1 1 0 B の配線を電氣的に接続することができるため、第 1 基板 1 1 0 A、第 2 基板 1 1 0 B 及び第 3 基板 1 1 0 C の信号線及び電源線の各々は互いに電氣的に接続され得る。

[0182] さらに、図 1 1 E に示すように、固体撮像装置 1 1 D の構造に対して、第 1 基板 1 1 0 A の裏面側には導電材料層 5 1 0 が設けられ、導電材料層 5 1

0の上にはパッド151が設けられてもよい。導電材料層510が第1基板110Aの裏面側に露出したTSV157の上に延伸されるように設けられることで、外部回路との接点となるパッド151は、TSV157、電極接合構造159を介して、第1基板110A、第2基板110B及び第3基板110Cの信号線及び電源線の各々と電氣的に接続することができる。

[0183] さらに、図11Fに示すように、固体撮像装置11Eの構造に対して、パッド151は、絶縁膜109の内部に埋め込まれて形成されてもよい。

[0184] また、図11Gに示すように、固体撮像装置11Eの構造に対して、TSV157は、第1の貫通孔及び第2の貫通孔に導電材料が埋め込まれた構造に替えて、第1の貫通孔及び第2の貫通孔の内壁に導電材料が成膜された構造にて設けられてもよい。具体的には、TSV157の第1の貫通孔及び第2の貫通孔（すなわち、引き出し線開口部155a、155b）に導電材料層510が成膜され、導電材料層510によって、第1基板110Aの多層配線層105内の配線、及び第2基板110Bの多層配線層125内の配線は、電氣的に接続される。このような場合、TSV157は、引き出し線開口部155a、155bの内壁に成膜された導電材料層510によって、パッド151と、各基板の多層配線層内の配線とを電氣的に接続するパッド引き出し構造と類似した構造を取り得る。よって、TSV157は、パッド引き出し構造の機能を兼ねることも可能である。

[0185] さらに、図11Hに示すように、固体撮像装置11Gの構造に対して、パッド151は、絶縁膜109の内部に埋め込まれて形成されてもよい。

[0186] なお、図11A～図11Hで示した固体撮像装置11A～11Hにおいて、導電材料層510は、引き出し線開口部155a、155bごとに電氣的に離隔されて設けられてもよい。また、パッド151は、引き出し線開口部155a、155bごとに設けられていてもよく、1つの引き出し線開口部155a、155bにつき複数設けられてもよい。また、TSV157は、パッド151と同様の第2の金属によって形成される配線に接続してもよく、通常の配線と同様の第1の金属によって形成される配線に接続してもよい。

。

[0187] (4-7. 第7の構成例)

続いて、図12A～図12Pを参照して、第7の構成例に係る固体撮像装置12A～12Pについて説明する。図12A～図12Pは、第7の構成例に係る固体撮像装置12A～12Pの一例を示す縦断面図である。

[0188] 第7の構成例に係る固体撮像装置12A～12Pでは、第1基板110Aの信号線及び電源線と、第2基板110Bの信号線及び電源線とを電氣的に接続するツインコンタクト構造のTSV157aに加えて、第2基板110Bの多層配線層125内の配線を露出させる第1の貫通孔と、第3基板110Cの多層配線層135内の配線を露出させる第2の貫通孔とに導電材料が埋め込まれたツインコンタクト構造のTSV157bがさらに設けられ、第2基板110B及び第3基板110Cの貼り合わせ面に、互いの電極が直接接触する状態で接合された電極接合構造159がさらに設けられる。

[0189] 具体的には、図12Aに示すように、TSV157aは、第2基板110Bの表面側から第2基板110Bを貫通し、第1基板110Aの多層配線層105内の配線を露出させる第1の貫通孔と、第2基板110Bの表面側から第2基板110Bの多層配線層125内の配線を露出させる第2の貫通孔とに導電材料が埋め込まれた構造にて設けられる。TSV157bは、第3基板110Cの裏面側から第3基板110Cを貫通し、第2基板110Bの多層配線層125内の配線を露出させる第1の貫通孔と、第3基板110Cの裏面側から半導体基板131を貫通し、第3基板110Cの多層配線層135内の配線を露出させる第2の貫通孔とに導電材料が埋め込まれた構造にて設けられる。また、電極接合構造159は、第2基板110Bの多層配線層125の最上層に設けられた電極と、第3基板110Cの多層配線層135の最上層に設けられた電極とを直接接触した状態で接合することで形成される。これにより、固体撮像装置12Aでは、TSV157a、157b及び電極接合構造159を介して、第1基板110A、第2基板110B及び第3基板110Cの信号線及び電源線の各々が互いに電氣的に接続される。

また、パッド151は、第1基板110Aの多層配線層105、第2基板110Bの多層配線層125、又は第3基板110Cの多層配線層135のいずれかの内部に設けられていればよい。

[0190] また、図12Bに示すように、パッド151は、第1基板110Aの裏面側に設けられ、引き出し線開口部155の内壁に成膜された導電材料層510によって第1基板110Aの多層配線層105内の配線と電氣的に接続してもよい。具体的には、引き出し線開口部155は、第1基板110Aの裏面側から半導体基板101を貫通し、第1基板110Aの多層配線層105内の配線を露出させるように形成される。また、引き出し線開口部155の内壁には、タングステン(W)などで形成された導電材料層510が成膜され、導電材料層510は、第1基板110Aの裏面側の絶縁膜109の上まで延伸される。さらに、第1基板110Aの裏面側の絶縁膜109の上に延伸された導電材料層510の上には、パッド151が設けられる。すなわち、パッド151は、第1基板110Aの裏面上に設けられ、導電材料層510を介して各基板の多層配線層105、125、135内の配線と電氣的に接続してもよい。

[0191] さらに、図12Cに示すように、固体撮像装置12Bの構造に対して、パッド151は、絶縁膜109の内部に埋め込まれて形成されてもよい。

[0192] また、図12Dに示すように、TSV157aは、第1基板110Aの裏面側から第1基板110Aを貫通して設けられてもよい。具体的には、TSV157aは、第1基板110Aの裏面側から半導体基板101を貫通し、第1基板110Aの多層配線層105内の配線を露出させる第1の貫通孔と、第1基板110Aの裏面側から第1基板110Aを貫通し、第2基板110Bの多層配線層125内の配線を露出させる第2の貫通孔とに導電材料が埋め込まれた構造にて設けられてもよい。これによっても、TSV157aは、第1基板110Aの配線及び第2基板110Bの配線を電氣的に接続することができるため、第1基板110A、第2基板110B及び第3基板110Cの信号線及び電源線の各々は互いに電氣的に接続され得る。

[0193] また、図12Eに示すように、固体撮像装置12Dの構造に対して、第1基板110Aの裏面側には導電材料層510が設けられ、導電材料層510の上にはパッド151が設けられてもよい。導電材料層510が第1基板110Aの裏面側に露出したTSV157aの上に延伸されるように設けられることで、外部回路との接点となるパッド151は、TSV157a、157b、及び電極接合構造159を介して、第1基板110A、第2基板110B及び第3基板110Cの信号線及び電源線の各々と互いに電氣的に接続することができる。

[0194] さらに、図12Fに示すように、固体撮像装置12Eの構造に対して、パッド151は、絶縁膜109の内部に埋め込まれて形成されてもよい。

[0195] また、図12Gに示すように、固体撮像装置12Eの構造に対して、TSV157aは、第1の貫通孔及び第2の貫通孔に導電材料が埋め込まれた構造に替えて、第1の貫通孔及び第2の貫通孔の内壁に導電材料が成膜された構造にて設けられてもよい。具体的には、TSV157aの第1の貫通孔及び第2の貫通孔（すなわち、引き出し線開口部155b、155a）に導電材料層510が成膜され、導電材料層510によって、第1基板110Aの多層配線層105内の配線、及び第2基板110Bの多層配線層125内の配線は、電氣的に接続される。このような場合、TSV157aは、引き出し線開口部155a、155bの内壁に成膜された導電材料層510によって、パッド151と、各基板の多層配線層内の配線とを電氣的に接続するパッド引き出し構造と類似した構造を取り得る。よって、TSV157aは、パッド引き出し構造の機能を兼ねることも可能である。

[0196] さらに、図12Hに示すように、固体撮像装置12Gの構造に対して、パッド151は、絶縁膜109の内部に埋め込まれて形成されてもよい。

[0197] また、図12Iに示すように、TSV157bは、第2基板110Bの裏面側から第2基板110Bを貫通して設けられてもよい。具体的には、TSV157bは、第2基板110Bの裏面側から半導体基板121を貫通し、第2基板110Bの多層配線層125内の配線を露出させる第1の貫通孔と

、第2基板110Bの裏面側から第2基板110Bを貫通し、第3基板110Cの多層配線層135内の配線を露出させる第2の貫通孔とに導電材料が埋め込まれた構造にて設けられてもよい。これによっても、TSV157bは、第2基板110Bの配線及び第3基板110Cの配線を電氣的に接続することができるため、第1基板110A、第2基板110B及び第3基板110Cの信号線及び電源線の各々は互いに電氣的に接続され得る。

[0198] また、図12Jに示すように、固体撮像装置12Iの構造に対して、パッド151は、第1基板110Aの裏面側に設けられ、引き出し線開口部155の内壁に成膜された導電材料層510によって第1基板110Aの多層配線層105内の配線と電氣的に接続してもよい。具体的には、引き出し線開口部155は、第1基板110Aの裏面側から半導体基板101を貫通し、第1基板110Aの多層配線層105内の配線を露出させるように形成される。また、引き出し線開口部155の内壁には、タングステン(W)などで形成された導電材料層510が成膜され、導電材料層510は、第1基板110Aの裏面側の絶縁膜109の上まで延伸される。さらに、第1基板110Aの裏面側の絶縁膜109の上に延伸された導電材料層510の上には、パッド151が設けられる。これにより、パッド151は、導電材料層510を介して第1基板110Aの多層配線層105内の配線と電氣的に接続することができる。

[0199] さらに、図12Kに示すように、固体撮像装置12Jの構造に対して、パッド151は、絶縁膜109の内部に埋め込まれて形成されてもよい。

[0200] また、図12Lに示すように、固体撮像装置12Iの構造に対して、TSV157aは、第1基板110Aの裏面側から第1基板110Aを貫通して設けられてもよい。具体的には、TSV157aは、第1基板110Aの裏面側から半導体基板101を貫通し、第1基板110Aの多層配線層105内の配線を露出させる第1の貫通孔と、第1基板110Aの裏面側から第1基板110Aを貫通し、第2基板110Bの多層配線層125内の配線を露出させる第2の貫通孔とに導電材料が埋め込まれた構造にて設けられてもよ

い。これによっても、TSV157aは、第1基板110Aの配線及び第2基板110Bの配線を電氣的に接続することができるため、第1基板110A、第2基板110B及び第3基板110Cの信号線及び電源線の各々は互いに電氣的に接続され得る。

[0201] さらに、図12Mに示すように、固体撮像装置12Lの構造に対して、第1基板110Aの裏面側には導電材料層510が設けられ、導電材料層510の上にはパッド151が設けられてもよい。導電材料層510が第1基板110Aの裏面側に露出したTSV157aの上に延伸されるように設けられることで、外部回路との接点となるパッド151は、TSV157a、157b、及び電極接合構造159を介して、第1基板110A、第2基板110B及び第3基板110Cの信号線及び電源線の各々と互いに電氣的に接続することができる。

[0202] さらに、図12Nに示すように、固体撮像装置12Mの構造に対して、パッド151は、絶縁膜109の内部に埋め込まれて形成されてもよい。

[0203] また、図12Oに示すように、固体撮像装置12Mの構造に対して、TSV157aは、第1の貫通孔及び第2の貫通孔に導電材料が埋め込まれた構造に替えて、第1の貫通孔及び第2の貫通孔の内壁に導電材料が成膜された構造にて設けられてもよい。具体的には、TSV157aの第1の貫通孔及び第2の貫通孔（すなわち、引き出し線開口部155b、155a）に導電材料層510が成膜され、導電材料層510によって、第1基板110Aの多層配線層105内の配線、及び第2基板110Bの多層配線層125内の配線は、電氣的に接続される。このような場合、TSV157aは、引き出し線開口部155a、155bの内壁に成膜された導電材料層510によって、パッド151と、各基板の多層配線層内の配線とを電氣的に接続するパッド引き出し構造と類似した構造を取り得る。よって、TSV157aは、パッド引き出し構造の機能を兼ねることも可能である。

[0204] さらに、図12Pに示すように、固体撮像装置12Oの構造に対して、パッド151は、絶縁膜109の内部に埋め込まれて形成されてもよい。

[0205] なお、図12A～図12Pで示した固体撮像装置12A～12Pにおいて、導電材料層510は、引き出し線開口部155a、155bごとに電氣的に離隔されて設けられてもよい。また、パッド151は、引き出し線開口部155a、155bごとに設けられていてもよく、1つの引き出し線開口部155a、155bにつき複数設けられてもよい。また、TSV157a、157bは、パッド151と同様の第2の金属によって形成される配線に接続してもよく、通常の配線と同様の第1の金属によって形成される配線に接続してもよい。

[0206] (4-8. 第8の構成例)

次に、図13A～図13Jを参照して、第8の構成例に係る固体撮像装置13A～13Jについて説明する。図13A～図13Jは、第8の構成例に係る固体撮像装置13A～13Jの一例を示す縦断面図である。

[0207] 第8の構成例に係る固体撮像装置13A～13Jでは、第1基板110Aの信号線及び電源線と、第2基板110Bの信号線及び電源線とを電氣的に接続するツインコンタクト構造のTSV157aに加えて、第1基板110Aの裏面側から第2基板110Bの多層配線層125内の配線を露出させる第1の貫通孔と、第1基板110Aの裏面側から第3基板110Cの多層配線層135内の配線を露出させる第2の貫通孔とに導電材料が埋め込まれたツインコンタクト構造のTSV157bがさらに設けられ、第2基板110B及び第3基板110Cの貼り合わせ面に、互いの電極が直接接触する状態で接合された電極接合構造159がさらに設けられる。

[0208] 具体的には、図13Aに示すように、TSV157aは、第2基板110Bの表面側から第2基板110Bを貫通し、第1基板110Aの多層配線層105内の配線を露出させる第1の貫通孔と、第2基板110Bの表面側から第2基板110Bの多層配線層125内の配線を露出させる第2の貫通孔とに導電材料が埋め込まれた構造にて設けられる。TSV157bは、第1基板110Aの裏面側から第1基板110Aを貫通し、第2基板110Bの多層配線層125内の配線を露出させる第1の貫通孔と、第1基板110A

の裏面側から第1基板110A及び第2基板110Bを貫通し、第3基板110Cの多層配線層135内の配線を露出させる第2の貫通孔とに導電材料が埋め込まれた構造にて設けられる。また、電極接合構造159は、第2基板110Bの多層配線層125の最上層に設けられた電極と、第3基板110Cの多層配線層135の最上層に設けられた電極とを直接接触した状態で接合することで形成される。これにより、固体撮像装置13Aでは、TSV157a、157b及び電極接合構造159を介して、第1基板110A、第2基板110B及び第3基板110Cの信号線及び電源線の各々が互いに電氣的に接続される。また、パッド151は、第1基板110Aの多層配線層105、第2基板110Bの多層配線層125、又は第3基板110Cの多層配線層135のいずれかの内部に設けられていればよい。

[0209] また、図13Bに示すように、固体撮像装置13Aの構造に対して、第1基板110Aの裏面側には導電材料層510が設けられ、導電材料層510の上にはパッド151が設けられてもよい。導電材料層510が第1基板110Aの裏面側に露出したTSV157bの上に延伸されるように設けられることで、外部回路との接点となるパッド151は、TSV157a、157b、及び電極接合構造159を介して、第1基板110A、第2基板110B及び第3基板110Cの信号線及び電源線の各々と互いに電氣的に接続することができる。

[0210] さらに、図13Cに示すように、固体撮像装置13Bの構造に対して、パッド151は、絶縁膜109の内部に埋め込まれて形成されてもよい。

[0211] また、図13Dに示すように、TSV157bは、第1の貫通孔及び第2の貫通孔に導電材料が埋め込まれた構造に替えて、第1の貫通孔及び第2の貫通孔の内壁に導電材料が成膜された構造にて設けられてもよい。具体的には、TSV157bの第1の貫通孔及び第2の貫通孔（すなわち、引き出し線開口部155b、155a）に導電材料層510が成膜され、導電材料層510によって、第2基板110Bの多層配線層125内の配線、及び第3基板110Cの多層配線層135内の配線は、電氣的に接続される。このよ

うな場合、TSV157bは、引き出し線開口部155a、155bの内壁に成膜された導電材料層510によって、パッド151と、各基板の多層配線層内の配線とを電氣的に接続するパッド引き出し構造と類似した構造を取り得る。よって、TSV157bは、パッド引き出し構造の機能を兼ねることも可能である。

[0212] さらに、図13Eに示すように、固体撮像装置13Dの構造に対して、パッド151は、絶縁膜109の内部に埋め込まれて形成されてもよい。

[0213] また、図13Fに示すように、TSV157aは、第1基板110Aの裏面側から第1基板110Aを貫通して設けられてもよい。具体的には、TSV157aは、第1基板110Aの裏面側から半導体基板101を貫通し、第1基板110Aの多層配線層105内の配線を露出させる第1の貫通孔と、第1基板110Aの裏面側から第1基板110Aを貫通し、第2基板110Bの多層配線層125内の配線を露出させる第2の貫通孔とに導電材料が埋め込まれた構造にて設けられてもよい。これによっても、TSV157aは、第1基板110Aの配線及び第2基板110Bの配線を電氣的に接続することができるため、第1基板110A、第2基板110B及び第3基板110Cの信号線及び電源線の各々は互いに電氣的に接続され得る。なお、TSV157a及びTSV157bが接続する第2基板110Bの多層配線層125内の配線は、同じであってもよく、互いに異なってもよい。

[0214] また、図13Gに示すように、固体撮像装置13Fの構造に対して、第1基板110Aの裏面側には導電材料層510が設けられ、導電材料層510の上にはパッド151が設けられてもよい。導電材料層510が第1基板110Aの裏面側に露出したTSV157a、157bの上に延伸されるように設けられることで、外部回路との接点となるパッド151は、TSV157a、157b、及び電極接合構造159を介して、第1基板110A、第2基板110B及び第3基板110Cの信号線及び電源線の各々と互いに電氣的に接続することができる。

[0215] さらに、図13Hに示すように、固体撮像装置13Gの構造に対して、パ

ッド151は、絶縁膜109の内部に埋め込まれて形成されてもよい。

[0216] また、図13Iに示すように、固体撮像装置13Gの構造に対して、TSV157a、157bは、各々の貫通孔に導電材料が埋め込まれた構造に替えて、各々の貫通孔の内壁に導電材料が成膜された構造にて設けられてもよい。具体的には、TSV157aの第1の貫通孔及び第2の貫通孔（すなわち、引き出し線開口部155b、155a）に導電材料層510が成膜され、導電材料層510によって、第1基板110Aの多層配線層105内の配線、及び第2基板110Bの多層配線層125内の配線は、電氣的に接続される。また、TSV157bの第1の貫通孔及び第2の貫通孔（すなわち、引き出し線開口部155c、155d）に導電材料層510が成膜され、導電材料層510によって、第2基板110Bの多層配線層125内の配線、及び第3基板110Cの多層配線層135内の配線は、電氣的に接続される。このような場合、TSV157a、157bは、引き出し線開口部155a、155b、155c、155dの内壁に成膜された導電材料層510によって、パッド151と、各基板の多層配線層内の配線とを電氣的に接続するパッド引き出し構造と類似した構造を取り得る。よって、TSV157a、157bは、パッド引き出し構造の機能を兼ねることも可能である。

[0217] さらに、図13Jに示すように、固体撮像装置13Iの構造に対して、パッド151は、絶縁膜109の内部に埋め込まれて形成されてもよい。

[0218] なお、図13A～図13Jで示した固体撮像装置13A～13Jにおいて、導電材料層510は、引き出し線開口部155a、155b、155c、155dごとに電氣的に離隔されて設けられてもよい。また、パッド151は、引き出し線開口部155a、155b、155c、155dごとに設けられていてもよく、1つの引き出し線開口部155a、155b、155c、155dにつき複数設けられてもよい。また、TSV157a、157bは、パッド151と同様の第2の金属によって形成される配線に接続してもよく、通常の配線と同様の第1の金属によって形成される配線に接続してもよい。

[0219] (4-9. 第9の構成例)

続いて、図14A～図14Pを参照して、第9の構成例に係る固体撮像装置14A～14Pについて説明する。図14A～図14Pは、第9の構成例に係る固体撮像装置14A～14Pの一例を示す縦断面図である。

[0220] 第9の構成例に係る固体撮像装置14A～14Pでは、第1基板110Aの信号線及び電源線と、第2基板110Bの信号線及び電源線とを電氣的に接続するツインコンタクト構造のTSV157aに加えて、第2基板110Bの多層配線層125内の配線、及び第3基板110Cの多層配線層135内の配線と接続し、1つの貫通孔に導電材料が埋め込まれたシェアードコンタクト構造のTSV157bがさらに設けられ、第2基板110B及び第3基板110Cの貼り合わせ面に設けられた互いの電極を接触状態で接合した電極接合構造159がさらに設けられる。

[0221] 具体的には、図14Aに示すように、TSV157aは、第2基板110Bの表面側から第2基板110Bを貫通し、第1基板110Aの多層配線層105内の配線を露出させる第1の貫通孔と、第2基板110Bの表面側から第2基板110Bの多層配線層125内の配線を露出させる第2の貫通孔とに導電材料が埋め込まれた構造にて設けられる。TSV157bは、第3基板110Cの裏面側から第3基板110Cを貫通して設けられ、第3基板110Cの多層配線層135内の配線と接触して第2基板110Bの多層配線層125内の配線を露出させる1つの貫通孔に導電材料が埋め込まれた構造にて設けられる。また、電極接合構造159は、第2基板110Bの多層配線層125の最上層に設けられた電極と、第3基板110Cの多層配線層135の最上層に設けられた電極とを直接接触した状態で接合することで形成される。これにより、固体撮像装置14Aでは、TSV157a、157b及び電極接合構造159を介して、第1基板110A、第2基板110B及び第3基板110Cの信号線及び電源線の各々が互いに電氣的に接続される。また、パッド151は、第1基板110Aの多層配線層105、第2基板110Bの多層配線層125、又は第3基板110Cの多層配線層135

のいずれかの内部に設けられていればよい。

[0222] また、図14Bに示すように、パッド151は、第1基板110Aの裏面側に設けられ、引き出し線開口部155の内壁に成膜された導電材料層510によって第1基板110Aの多層配線層105内の配線と電氣的に接続してもよい。具体的には、引き出し線開口部155は、第1基板110Aの裏面側から半導体基板101を貫通し、第1基板110Aの多層配線層105内の配線を露出させるように形成される。また、引き出し線開口部155の内壁には、タングステン(W)などで形成された導電材料層510が成膜され、導電材料層510は、第1基板110Aの裏面側の絶縁膜109の上まで延伸される。さらに、第1基板110Aの裏面側の絶縁膜109の上に延伸された導電材料層510の上には、パッド151が設けられる。すなわち、パッド151は、第1基板110Aの裏面上に設けられ、導電材料層510を介して各基板の多層配線層105、125、135内の配線と電氣的に接続してもよい。

[0223] さらに、図14Cに示すように、固体撮像装置14Bの構造に対して、パッド151は、絶縁膜109の内部に埋め込まれて形成されてもよい。

[0224] また、図14Dに示すように、TSV157aは、第1基板110Aの裏面側から第1基板110Aを貫通して設けられてもよい。具体的には、TSV157aは、第1基板110Aの裏面側から半導体基板101を貫通し、第1基板110Aの多層配線層105内の配線を露出させる第1の貫通孔と、第1基板110Aの裏面側から第1基板110Aを貫通し、第2基板110Bの多層配線層125内の配線を露出させる第2の貫通孔とに導電材料が埋め込まれた構造にて設けられてもよい。これによっても、TSV157aは、第1基板110Aの配線及び第2基板110Bの配線を電氣的に接続することができるため、第1基板110A、第2基板110B及び第3基板110Cの信号線及び電源線の各々は互いに電氣的に接続され得る。

[0225] また、図14Eに示すように、固体撮像装置14Dの構造に対して、第1基板110Aの裏面側には導電材料層510が設けられ、導電材料層510

の上にはパッド151が設けられてもよい。導電材料層510が第1基板110Aの裏面側に露出したTSV157aの上に延伸されるように設けられることで、外部回路との接点となるパッド151は、TSV157a、157b、及び電極接合構造159を介して、第1基板110A、第2基板110B及び第3基板110Cの信号線及び電源線の各々と互いに電氣的に接続することができる。

[0226] さらに、図14Fに示すように、固体撮像装置14Eの構造に対して、パッド151は、絶縁膜109の内部に埋め込まれて形成されてもよい。

[0227] また、図14Gに示すように、固体撮像装置14Eの構造に対して、TSV157aは、第1の貫通孔及び第2の貫通孔に導電材料が埋め込まれた構造に替えて、第1の貫通孔及び第2の貫通孔の内壁に導電材料が成膜された構造にて設けられてもよい。具体的には、TSV157aの第1の貫通孔及び第2の貫通孔（すなわち、引き出し線開口部155b、155a）に導電材料層510が成膜され、導電材料層510によって、第1基板110Aの多層配線層105内の配線、及び第2基板110Bの多層配線層125内の配線は、電氣的に接続される。このような場合、TSV157aは、引き出し線開口部155a、155bの内壁に成膜された導電材料層510によって、パッド151と、各基板の多層配線層内の配線とを電氣的に接続するパッド引き出し構造と類似した構造を取り得る。よって、TSV157aは、パッド引き出し構造の機能を兼ねることも可能である。

[0228] さらに、図14Hに示すように、固体撮像装置14Gの構造に対して、パッド151は、絶縁膜109の内部に埋め込まれて形成されてもよい。

[0229] また、図14Iに示すように、TSV157bは、第2基板110Bの裏面側から第2基板110Bを貫通して設けられてもよい。具体的には、TSV157bは、第2基板110Bの裏面側から第2基板110Bを貫通し、第2基板110Bの多層配線層125内の配線と接触して第3基板110Cの多層配線層135内の配線を露出させる1つの貫通孔に導電材料が埋め込まれた構造にて設けられてもよい。これによっても、TSV157bは、第

2基板110Bの配線及び第3基板110Cの配線を電氣的に接続することができるため、第1基板110A、第2基板110B及び第3基板110Cの信号線及び電源線の各々は電氣的に接続され得る。

[0230] また、図14Jに示すように、固体撮像装置14Iの構造に対して、パッド151は、第1基板110Aの裏面側に設けられ、引き出し線開口部155の内壁に成膜された導電材料層510によって第1基板110Aの多層配線層105内の配線と電氣的に接続してもよい。具体的には、引き出し線開口部155は、第1基板110Aの裏面側から半導体基板101を貫通し、第1基板110Aの多層配線層105内の配線を露出させるように形成される。また、引き出し線開口部155の内壁には、タングステン(W)などで形成された導電材料層510が成膜され、導電材料層510は、第1基板110Aの裏面側の絶縁膜109の上まで延伸される。さらに、第1基板110Aの裏面側の絶縁膜109の上に延伸された導電材料層510の上には、パッド151が設けられる。これにより、パッド151は、導電材料層510を介して第1基板110Aの多層配線層105内の配線と電氣的に接続することができる。

[0231] さらに、図14Kに示すように、固体撮像装置14Jの構造に対して、パッド151は、絶縁膜109の内部に埋め込まれて形成されてもよい。

[0232] また、図14Lに示すように、固体撮像装置14Iの構造に対して、TSV157aは、第1基板110Aの裏面側から第1基板110Aを貫通して設けられてもよい。具体的には、TSV157aは、第1基板110Aの裏面側から半導体基板101を貫通し、第1基板110Aの多層配線層105内の配線を露出させる第1の貫通孔と、第1基板110Aの裏面側から第1基板110Aを貫通し、第2基板110Bの多層配線層125内の配線を露出させる第2の貫通孔とに導電材料が埋め込まれた構造にて設けられてもよい。これによっても、TSV157aは、第1基板110Aの配線及び第2基板110Bの配線を電氣的に接続することができるため、第1基板110A、第2基板110B及び第3基板110Cの信号線及び電源線の各々は互

いに電氣的に接続され得る。

[0233] さらに、図14Mに示すように、固体撮像装置14Lの構造に対して、第1基板110Aの裏面側には導電材料層510が設けられ、導電材料層510の上にはパッド151が設けられてもよい。導電材料層510が第1基板110Aの裏面側に露出したTSV157aの上に延伸されるように設けられることで、外部回路との接点となるパッド151は、TSV157a、157b、及び電極接合構造159を介して、第1基板110A、第2基板110B及び第3基板110Cの信号線及び電源線の各々と互いに電氣的に接続することができる。

[0234] さらに、図14Nに示すように、固体撮像装置14Mの構造に対して、パッド151は、絶縁膜109の内部に埋め込まれて形成されてもよい。

[0235] また、図14Oに示すように、固体撮像装置14Mの構造に対して、TSV157aは、第1の貫通孔及び第2の貫通孔に導電材料が埋め込まれた構造に替えて、第1の貫通孔及び第2の貫通孔の内壁に導電材料が成膜された構造にて設けられてもよい。具体的には、TSV157aの第1の貫通孔及び第2の貫通孔（すなわち、引き出し線開口部155b、155a）に導電材料層510が成膜され、導電材料層510によって、第1基板110Aの多層配線層105内の配線、及び第2基板110Bの多層配線層125内の配線は、電氣的に接続される。このような場合、TSV157aは、引き出し線開口部155a、155bの内壁に成膜された導電材料層510によって、パッド151と、各基板の多層配線層内の配線とを電氣的に接続するパッド引き出し構造と類似した構造を取り得る。よって、TSV157aは、パッド引き出し構造の機能を兼ねることも可能である。

[0236] さらに、図14Pに示すように、固体撮像装置14Oの構造に対して、パッド151は、絶縁膜109の内部に埋め込まれて形成されてもよい。

[0237] なお、図14A～図14Pで示した固体撮像装置14A～14Pにおいて、導電材料層510は、引き出し線開口部155a、155bごとに電氣的に離隔されて設けられてもよい。また、パッド151は、引き出し線開口部

155a、155bごとに設けられていてもよく、1つの引き出し線開口部155a、155bにつき複数設けられてもよい。また、TSV157a、157bは、パッド151と同様の第2の金属によって形成される配線に接続してもよく、通常の配線と同様の第1の金属によって形成される配線に接続してもよい。

[0238] (4-10. 第10の構成例)

次に、図15A～図15Jを参照して、第10の構成例に係る固体撮像装置15A～15Jについて説明する。図15A～図15Jは、第10の構成例に係る固体撮像装置15A～15Jの一例を示す縦断面図である。

[0239] 第10の構成例に係る固体撮像装置15A～15Jでは、第1基板110Aの信号線及び電源線と、第2基板110Bの信号線及び電源線とを電氣的に接続するツインコンタクト構造のTSV157aに加えて、第2基板110Bの多層配線層125内の配線、及び第3基板110Cの多層配線層135内の配線と接続し、第1基板110Aの裏面側から第1基板110A及び第2基板110Bを貫通して設けられた1つの貫通孔に導電材料が埋め込まれたシェアードコンタクト構造のTSV157bがさらに設けられ、第2基板110B及び第3基板110Cの貼り合わせ面に設けられた互いの電極を接触状態で接合した電極接合構造159がさらに設けられる。

[0240] 具体的には、図15Aに示すように、TSV157aは、第2基板110Bの表面側から第2基板110Bを貫通し、第1基板110Aの多層配線層105内の配線を露出させる第1の貫通孔と、第2基板110Bの多層配線層125内の配線を露出させる第2の貫通孔とに導電材料が埋め込まれた構造にて設けられる。TSV157bは、第1基板110Aの裏面側から第1基板110A及び第2基板110Bを貫通して設けられ、第2基板110Bの多層配線層125内の配線と接触して、第3基板110Cの多層配線層135内の配線を露出させる1つの貫通孔に導電材料が埋め込まれた構造にて設けられる。また、電極接合構造159は、第2基板110Bの多層配線層125の最上層に設けられた電極と、第3基板110Cの多層配線層135

の最上層に設けられた電極とを直接接触した状態で接合することで形成される。これにより、固体撮像装置 15 A では、TSV 157 a、157 b 及び電極接合構造 159 を介して、第 1 基板 110 A、第 2 基板 110 B 及び第 3 基板 110 C の信号線及び電源線の各々が互いに電氣的に接続される。また、パッド 151 は、第 1 基板 110 A の多層配線層 105、第 2 基板 110 B の多層配線層 125、又は第 3 基板 110 C の多層配線層 135 のいずれかの内部に設けられていればよい。

[0241] また、図 15 B に示すように、固体撮像装置 15 A の構造に対して、第 1 基板 110 A の裏面側には導電材料層 510 が設けられ、導電材料層 510 の上にはパッド 151 が設けられてもよい。導電材料層 510 が第 1 基板 110 A の裏面側に露出した TSV 157 b の上に延伸されるように設けられることで、外部回路との接点となるパッド 151 は、TSV 157 a、157 b、及び電極接合構造 159 を介して、第 1 基板 110 A、第 2 基板 110 B 及び第 3 基板 110 C の信号線及び電源線の各々と互いに電氣的に接続することができる。

[0242] さらに、図 15 C に示すように、固体撮像装置 15 B の構造に対して、パッド 151 は、絶縁膜 109 の内部に埋め込まれて形成されてもよい。

[0243] また、図 15 D に示すように、TSV 157 b は、貫通孔に導電材料が埋め込まれた構造に替えて、貫通孔の内壁に導電材料が成膜された構造にて設けられてもよい。具体的には、TSV 157 b の貫通孔（すなわち、引き出し線開口部 155）に導電材料層 510 が成膜され、導電材料層 510 によって、第 2 基板 110 B の多層配線層 125 内の配線、及び第 3 基板 110 C の多層配線層 135 内の配線は、電氣的に接続される。このような場合、TSV 157 b は、引き出し線開口部 155 の内壁に成膜された導電材料層 510 によって、パッド 151 と、各基板の多層配線層内の配線とを電氣的に接続するパッド引き出し構造と類似した構造を取り得る。よって、TSV 157 b は、パッド引き出し構造の機能を兼ねることも可能である。

[0244] さらに、図 15 E に示すように、固体撮像装置 15 D の構造に対して、パ

ッド151は、絶縁膜109の内部に埋め込まれて形成されてもよい。

[0245] また、図15Fに示すように、TSV157aは、第1基板110Aの裏面側から第1基板110Aを貫通して設けられてもよい。具体的には、TSV157aは、第1基板110Aの裏面側から半導体基板101を貫通し、第1基板110Aの多層配線層105内の配線を露出させる第1の貫通孔と、第1基板110Aの裏面側から第1基板110Aを貫通し、第2基板110Bの多層配線層125内の配線を露出させる第2の貫通孔とに導電材料が埋め込まれた構造にて設けられてもよい。これによっても、TSV157aは、第1基板110Aの配線及び第2基板110Bの配線を電氣的に接続することができるため、第1基板110A、第2基板110B及び第3基板110Cの信号線及び電源線の各々は互いに電氣的に接続され得る。なお、TSV157a及びTSV157bが接続する第2基板110Bの多層配線層125内の配線は、同じであってもよく、互いに異なってもよい。

[0246] また、図15Gに示すように、固体撮像装置15Fの構造に対して、第1基板110Aの裏面側には導電材料層510が設けられ、導電材料層510の上にはパッド151が設けられてもよい。導電材料層510が第1基板110Aの裏面側に露出したTSV157a、157bの上に延伸されるように設けられることで、外部回路との接点となるパッド151は、TSV157a、157b、及び電極接合構造159を介して、第1基板110A、第2基板110B及び第3基板110Cの信号線及び電源線の各々と互いに電氣的に接続することができる。

[0247] さらに、図15Hに示すように、固体撮像装置15Gの構造に対して、パッド151は、絶縁膜109の内部に埋め込まれて形成されてもよい。

[0248] また、図15Iに示すように、固体撮像装置15Gの構造に対して、TSV157a、157bは、各々の貫通孔に導電材料が埋め込まれた構造に替えて、各々の貫通孔の内壁に導電材料が成膜された構造にて設けられてもよい。具体的には、TSV157aの第1の貫通孔及び第2の貫通孔（すなわち、引き出し線開口部155b、155a）に導電材料層510が成膜され

、導電材料層 510 によって、第 1 基板 110A の多層配線層 105 内の配線、及び第 2 基板 110B の多層配線層 125 内の配線は、電氣的に接続される。また、TSV157b の貫通孔（すなわち、引き出し線開口部 155c）に導電材料層 510 が成膜され、導電材料層 510 によって、第 2 基板 110B の多層配線層 125 内の配線、及び第 3 基板 110C の多層配線層 135 内の配線は、電氣的に接続される。このような場合、TSV157a、157b は、引き出し線開口部 155a、155b、155c の内壁に成膜された導電材料層 510 によって、パッド 151 と、各基板の多層配線層内の配線とを電氣的に接続するパッド引き出し構造と類似した構造を取り得る。よって、TSV157a、157b は、パッド引き出し構造の機能を兼ねることも可能である。

[0249] さらに、図 15J に示すように、固体撮像装置 15I の構造に対して、パッド 151 は、絶縁膜 109 の内部に埋め込まれて形成されてもよい。

[0250] なお、図 15A～図 15J で示した固体撮像装置 15A～15J において、導電材料層 510 は、引き出し線開口部 155a、155b、155c ごとに電氣的に離隔されて設けられてもよい。また、パッド 151 は、引き出し線開口部 155a、155b、155c ごとに設けられていてもよく、1 つの引き出し線開口部 155a、155b、155c につき複数設けられてもよい。また、TSV157a、157b は、パッド 151 と同様の第 2 の金属によって形成される配線に接続してもよく、通常の配線と同様の第 1 の金属によって形成される配線に接続してもよい。

[0251] （4-11. 第 11 の構成例）

次に、図 16A～図 16C を参照して、第 11 の構成例に係る固体撮像装置 16A～16C について説明する。図 16A～図 16C は、第 11 の構成例に係る固体撮像装置 16A～16C の一例を示す縦断面図である。

[0252] 第 11 の構成例に係る固体撮像装置 16A～16C では、第 3 基板 110C の裏面側から第 3 基板 110C および第 2 基板 110B を貫通して設けられ、第 1 基板 110A の多層配線層 105 内の配線、及び第 2 基板 110B

の多層配線層 1 2 5 内の配線を電氣的に接続するツインコンタクト構造の TSV 1 5 7 が設けられる。

[0253] 具体的には、図 1 6 A に示すように、TSV 1 5 7 は、第 3 基板 1 1 0 C の裏面側から第 3 基板 1 1 0 C 及び第 2 基板 1 1 0 B を貫通して設けられる。例えば、TSV 1 5 7 は、第 3 基板 1 1 0 C 及び第 2 基板 1 1 0 B を貫通し、第 1 基板 1 1 0 A の多層配線層 1 0 5 内の配線を露出させる第 1 の貫通孔と、第 3 基板 1 1 0 C を貫通し、第 2 基板 1 1 0 B の多層配線層 1 2 5 内の配線を露出させる第 2 の貫通孔とに導電材料が埋め込まれた構造にて設けられる。また、第 1 基板 1 1 0 A の多層配線層 1 0 5、及び第 3 基板 1 1 0 C の多層配線層 1 3 5 には、それぞれパッド 1 5 1 が設けられ、当該パッド 1 5 1 を露出されるようにパッド開口部 1 5 3 a、1 5 3 b が設けられる。よって、固体撮像装置 1 6 A では、パッド 1 5 1、パッド開口部 1 5 3 a、1 5 3 b、及び TSV 1 5 7 を介して第 1 基板 1 1 0 A、第 2 基板 1 1 0 B 及び第 3 基板 1 1 0 C の信号線及び電源線の各々が互いに電氣的に接続される。なお、パッド 1 5 1 は、第 3 基板 1 1 0 C の多層配線層 1 3 5 の内部と、第 1 基板 1 1 0 A の多層配線層 1 0 5 又は第 2 基板 1 1 0 B の多層配線層 1 2 5 のいずれかの内部とに少なくとも設けられていればよい。

[0254] また、図 1 6 B に示すように、パッド 1 5 1 は、第 1 基板 1 1 0 A の裏面側に設けられ、引き出し線開口部 1 5 5 a、1 5 5 b の内壁に成膜された導電材料層 5 1 0 によって、第 1 基板 1 1 0 A の多層配線層 1 0 5 内の配線、及び第 3 基板 1 1 0 C の多層配線層 1 3 5 内の配線と電氣的に接続してもよい。具体的には、引き出し線開口部 1 5 5 a は、第 1 基板 1 1 0 A の裏面側から半導体基板 1 0 1 を貫通し、第 1 基板 1 1 0 A の多層配線層 1 0 5 内の配線を露出させるように形成され、引き出し線開口部 1 5 5 b は、第 1 基板 1 1 0 A の裏面側から、第 1 基板 1 1 0 A 及び第 2 基板 1 1 0 B を貫通し、第 3 基板 1 1 0 C の多層配線層 1 3 5 内の配線を露出させるように形成される。また、引き出し線開口部 1 5 5 a、1 5 5 b の内壁には、タングステン (W) などで形成された導電材料層 5 1 0 が成膜され、導電材料層 5 1 0 は

、第1基板110Aの裏面側の絶縁膜109の上まで延伸される。さらに、第1基板110Aの裏面側の絶縁膜109の上に延伸された導電材料層510の上には、パッド151が設けられる。すなわち、パッド151は、第1基板110Aの裏面上に設けられ、導電材料層510を介して各基板の多層配線層105、125、135内の配線と電氣的に接続することができる。

[0255] さらに、図16Cに示すように、固体撮像装置16Bの構造に対して、パッド151は、絶縁膜109の内部に埋め込まれて形成されてもよい。

[0256] なお、図16A～図16Cで示した固体撮像装置16A～16Cにおいて、導電材料層510は、引き出し線開口部155a、155bごとに電氣的に離隔されて設けられてもよい。また、パッド151は、引き出し線開口部155a、155bごとに設けられていてもよく、1つの引き出し線開口部155a、155bにつき複数設けられてもよい。また、TSV157は、パッド151と同様の第2の金属によって形成される配線に接続してもよく、通常の配線と同様の第1の金属によって形成される配線に接続してもよい。

[0257] (第12の構成例)

次に、図17A～図17Fを参照して、第12の構成例に係る固体撮像装置17A～17Fについて説明する。図17A～図17Fは、第12の構成例に係る固体撮像装置17A～17Fの一例を示す縦断面図である。

[0258] 第12の構成例に係る固体撮像装置17A～17Fでは、第1基板110Aの信号線及び電源線と、第2基板110Bの信号線及び電源線とを電氣的に接続するツインコンタクト構造のTSV157aに加えて、第2基板110Bの多層配線層125内の配線を露出させる第1の貫通孔と、第3基板110Cの多層配線層135内の配線を露出させる第2の貫通孔とに導電材料が埋め込まれたツインコンタクト構造のTSV157aがさらに設けられる。

[0259] 具体的には、図17Aに示すように、TSV157aは、第3基板110Cの裏面側から第3基板110Cを貫通して設けられ、第3基板110C及

び第2基板110Bを貫通し、第1基板110Aの多層配線層105内の配線を露出させる第1の貫通孔と、第3基板110Cを貫通し、第2基板110Bの多層配線層125内の配線を露出させる第2の貫通孔とに導電材料が埋め込まれた構造にて設けられる。また、TSV157bは、第3基板110Cの裏面側から第3基板110Cを貫通して設けられ、第3基板110Cを貫通し、第2基板110Bの多層配線層125内の配線を露出させる第1の貫通孔と、第3基板110Cの裏面側から半導体基板131を貫通し、第3基板110Cの多層配線層135内の配線を露出させる第2の貫通孔とに導電材料が埋め込まれた構造にて設けられる。これにより、固体撮像装置17Aでは、TSV157a、157bを介して、第1基板110A、第2基板110B及び第3基板110Cの信号線及び電源線の各々が互いに電氣的に接続される。また、パッド151は、第1基板110Aの多層配線層105、第2基板110Bの多層配線層125、又は第3基板110Cの多層配線層135のいずれかの内部に設けられていればよい。

[0260] また、図17Bに示すように、パッド151は、第1基板110Aの裏面側に設けられ、引き出し線開口部155の内壁に成膜された導電材料層510によって第1基板110Aの多層配線層105内の配線と電氣的に接続してもよい。具体的には、引き出し線開口部155は、第1基板110Aの裏面側から半導体基板101を貫通し、第1基板110Aの多層配線層105内の配線を露出させるように形成される。また、引き出し線開口部155の内壁には、タングステン(W)などで形成された導電材料層510が成膜され、導電材料層510は、第1基板110Aの裏面側の絶縁膜109の上まで延伸される。さらに、第1基板110Aの裏面側の絶縁膜109の上に延伸された導電材料層510の上には、パッド151が設けられる。すなわち、パッド151は、第1基板110Aの裏面上に設けられ、導電材料層510を介して各基板の多層配線層105、125、135内の配線と電氣的に接続してもよい。

[0261] さらに、図17Cに示すように、固体撮像装置17Bの構造に対して、パ

ッド151は、絶縁膜109の内部に埋め込まれて形成されてもよい。

[0262] また、図17Dに示すように、TSV157bは、第2基板110Bの裏面側から第2基板110Bを貫通して設けられてもよい。具体的には、TSV157bは、第2基板110Bの裏面側から半導体基板121を貫通し、第2基板110Bの多層配線層125内の配線を露出させる第1の貫通孔と、第2基板110Bの裏面側から第2基板110Bを貫通し、第3基板110Cの多層配線層135内の配線を露出させる第2の貫通孔とに導電材料が埋め込まれた構造にて設けられてもよい。これによっても、TSV157bは、第2基板110Bの配線及び第3基板110Cの配線を電氣的に接続することができるため、第1基板110A、第2基板110B及び第3基板110Cの信号線及び電源線の各々は互いに電氣的に接続され得る。

[0263] さらに、図17Eに示すように、固体撮像装置17Dの構造に対して、パッド151は、第1基板110Aの裏面側に設けられ、引き出し線開口部155の内壁に成膜された導電材料層510によって第1基板110Aの多層配線層105内の配線と電氣的に接続してもよい。具体的には、引き出し線開口部155は、第1基板110Aの裏面側から半導体基板101を貫通し、第1基板110Aの多層配線層105内の配線を露出させるように形成される。また、引き出し線開口部155の内壁には、タングステン(W)などで形成された導電材料層510が成膜され、導電材料層510は、第1基板110Aの裏面側の絶縁膜109の上まで延伸される。さらに、第1基板110Aの裏面側の絶縁膜109の上に延伸された導電材料層510の上には、パッド151が設けられる。すなわち、パッド151は、第1基板110Aの裏面上に設けられ、導電材料層510を介して各基板の多層配線層105、125、135内の配線と電氣的に接続してもよい。

[0264] さらに、図17Fに示すように、固体撮像装置17Eの構造に対して、パッド151は、絶縁膜109の内部に埋め込まれて形成されてもよい。

[0265] なお、図17A～図17Fで示した固体撮像装置17A～17Fにおいて、パッド151は、1つの引き出し線開口部155に対して複数設けられて

もよい。また、TSV157a、157bは、パッド151と同様の第2の金属によって形成される配線に接続してもよく、通常の配線と同様の第1の金属によって形成される配線に接続してもよい。

[0266] (4-13. 第13の構成例)

続いて、図18A～図18Eを参照して、第13の構成例に係る固体撮像装置18A～8Eについて説明する。図18A～図18Eは、第13の構成例に係る固体撮像装置18A～18Eの一例を示す縦断面図である。

[0267] 第13の構成例に係る固体撮像装置18A～18Eでは、第1基板110Aの信号線及び電源線と、第2基板110Bの信号線及び電源線とを電氣的に接続するツインコンタクト構造のTSV157aに加えて、第1基板110Aの裏面側から第2基板110Bの多層配線層125内の配線を露出させる第1の貫通孔と、第1基板110Aの裏面側から第3基板110Cの多層配線層135内の配線を露出させる第2の貫通孔とに導電材料が埋め込まれたツインコンタクト構造のTSV157bがさらに設けられる。

[0268] 具体的には、図18Aに示すように、TSV157aは、第3基板110Cの裏面側から第3基板110C及び第2基板110Bを貫通し、第1基板110Aの多層配線層105内の配線を露出させる第1の貫通孔と、第3基板110Cの裏面側から第3基板110Cを貫通し、第2基板110Bの多層配線層125内の配線を露出させる第2の貫通孔とに導電材料が埋め込まれた構造にて設けられる。TSV157aは、第1基板110Aの裏面側から第1基板110Aを貫通し、第2基板110Bの多層配線層125内の配線を露出させる第1の貫通孔と、第1基板110Aの裏面側から第1基板110A及び第2基板110Bを貫通し、第3基板110Cの多層配線層135内の配線を露出させる第2の貫通孔とに導電材料が埋め込まれた構造にて設けられる。これにより、固体撮像装置18Aでは、TSV157a、157bを介して、第1基板110A、第2基板110B及び第3基板110Cの信号線及び電源線の各々が互いに電氣的に接続される。また、パッド151は、第1基板110Aの多層配線層105、第2基板110Bの多層配線

層 1 2 5、又は第 3 基板 1 1 0 C の多層配線層 1 3 5 のいずれかの内部に設けられていればよい。

[0269] また、図 1 8 B に示すように、固体撮像装置 1 8 A の構造に対して、第 1 基板 1 1 0 A の裏面側には導電材料層 5 1 0 が設けられ、導電材料層 5 1 0 の上にはパッド 1 5 1 が設けられてもよい。導電材料層 5 1 0 が第 1 基板 1 1 0 A の裏面側に露出した T S V 1 5 7 b の上に延伸されるように設けられることで、外部回路との接点となるパッド 1 5 1 は、T S V 1 5 7 a、1 5 7 b を介して、第 1 基板 1 1 0 A、第 2 基板 1 1 0 B 及び第 3 基板 1 1 0 C の各配線と互いに電氣的に接続することができる。

[0270] さらに、図 1 8 C に示すように、固体撮像装置 1 8 B の構造に対して、パッド 1 5 1 は、絶縁膜 1 0 9 の内部に埋め込まれて形成されてもよい。

[0271] また、図 1 8 D に示すように、固体撮像装置 1 8 A の構造に対して、T S V 1 5 7 b は、第 1 の貫通孔及び第 2 の貫通孔に導電材料が埋め込まれた構造に替えて、第 1 の貫通孔及び第 2 の貫通孔の内壁に導電材料が成膜された構造にて設けられてもよい。具体的には、T S V 1 5 7 b の第 1 の貫通孔及び第 2 の貫通孔（すなわち、引き出し線開口部 1 5 5 b、1 5 5 a）に導電材料層 5 1 0 が成膜され、導電材料層 5 1 0 によって、第 2 基板 1 1 0 B の多層配線層 1 2 5 内の配線、及び第 3 基板 1 1 0 C の多層配線層 1 3 5 内の配線は、電氣的に接続される。このような場合、T S V 1 5 7 b は、引き出し線開口部 1 5 5 a、1 5 5 b の内壁に成膜された導電材料層 5 1 0 によって、パッド 1 5 1 と、各基板の多層配線層内の配線とを電氣的に接続するパッド引き出し構造と類似した構造を取り得る。よって、T S V 1 5 7 b は、パッド引き出し構造の機能を兼ねることも可能である。

[0272] さらに、図 1 8 E に示すように、固体撮像装置 1 8 D の構造に対して、パッド 1 5 1 は、絶縁膜 1 0 9 の内部に埋め込まれて形成されてもよい。

[0273] なお、図 1 8 A ～図 1 8 E で示した固体撮像装置 1 8 A ～1 8 E において、導電材料層 5 1 0 は、引き出し線開口部 1 5 5 a、1 5 5 b ごとに電氣的に離隔されて設けられてもよい。また、パッド 1 5 1 は、引き出し線開口部

155a、155bごとに設けられていてもよく、1つの引き出し線開口部155a、155bにつき複数設けられてもよい。また、TSV157a、157bは、パッド151と同様の第2の金属によって形成される配線に接続してもよく、通常の配線と同様の第1の金属によって形成される配線に接続してもよい。

[0274] (4-14. 第14の構成例)

次に、図19A～図19Fを参照して、第14の構成例に係る固体撮像装置19A～19Fについて説明する。図19A～図19Fは、第14の構成例に係る固体撮像装置19A～19Fの一例を示す縦断面図である。

[0275] 第14の構成例に係る固体撮像装置19A～19Fでは、第1基板110Aの信号線及び電源線と、第2基板110Bの信号線及び電源線とを電氣的に接続するツインコンタクト構造のTSV157aに加えて、第2基板110Bの多層配線層125内の配線、及び第3基板110Cの多層配線層135内の配線と接続し、1つの貫通孔に導電材料が埋め込まれたシェアードコンタクト構造のTSV157bがさらに設けられる。

[0276] 具体的には、図19Aに示すように、TSV157aは、第3基板110Cの裏面側から第3基板110C及び第2基板110Bを貫通し、第1基板110Aの多層配線層105内の配線を露出させる第1の貫通孔と、第3基板110Cの裏面側から第3基板110Cを貫通し、第2基板110Bの多層配線層125内の配線を露出させる第2の貫通孔とに導電材料が埋め込まれた構造にて設けられる。TSV157bは、第3基板110Cの裏面側から第3基板110Cを貫通して設けられ、第3基板110Cの多層配線層135内の配線と接触して第2基板110Bの多層配線層125内の配線を露出させる1つの貫通孔に導電材料が埋め込まれた構造にて設けられる。これにより、固体撮像装置19Aでは、TSV157a、157bを介して、第1基板110A、第2基板110B及び第3基板110Cの信号線及び電源線の各々が互いに電氣的に接続される。また、パッド151は、第1基板110Aの多層配線層105、第2基板110Bの多層配線層125、又は第

3 基板 1 1 0 C の多層配線層 1 3 5 のいずれかの内部に設けられていればよい。

[0277] また、図 1 9 B に示すように、パッド 1 5 1 は、第 1 基板 1 1 0 A の裏面側に設けられ、引き出し線開口部 1 5 5 の内壁に成膜された導電材料層 5 1 0 によって第 1 基板 1 1 0 A の多層配線層 1 0 5 内の配線と電氣的に接続してもよい。具体的には、引き出し線開口部 1 5 5 は、第 1 基板 1 1 0 A の裏面側から半導体基板 1 0 1 を貫通し、第 1 基板 1 1 0 A の多層配線層 1 0 5 内の配線を露出させるように形成される。また、引き出し線開口部 1 5 5 の内壁には、タングステン (W) などで形成された導電材料層 5 1 0 が成膜され、導電材料層 5 1 0 は、第 1 基板 1 1 0 A の裏面側の絶縁膜 1 0 9 の上まで延伸される。さらに、第 1 基板 1 1 0 A の裏面側の絶縁膜 1 0 9 の上に延伸された導電材料層 5 1 0 の上には、パッド 1 5 1 が設けられる。すなわち、パッド 1 5 1 は、第 1 基板 1 1 0 A の裏面上に設けられ、導電材料層 5 1 0 を介して各基板の多層配線層 1 0 5、1 2 5、1 3 5 内の配線と電氣的に接続してもよい。

[0278] さらに、図 1 9 C に示すように、固体撮像装置 1 9 B の構造に対して、パッド 1 5 1 は、絶縁膜 1 0 9 の内部に埋め込まれて形成されてもよい。

[0279] また、図 1 9 D に示すように、TSV 1 5 7 b は、第 2 基板 1 1 0 B の裏面側から第 2 基板 1 1 0 B を貫通して設けられてもよい。具体的には、TSV 1 5 7 b は、第 2 基板 1 1 0 B の裏面側から第 2 基板 1 1 0 B を貫通し、第 2 基板 1 1 0 B の多層配線層 1 2 5 内の配線と接触して第 3 基板 1 1 0 C の多層配線層 1 3 5 内の配線を露出させる 1 つの貫通孔に導電材料が埋め込まれた構造にて設けられてもよい。これによっても、TSV 1 5 7 b は、第 2 基板 1 1 0 B の配線及び第 3 基板 1 1 0 C の配線を電氣的に接続することができるため、第 1 基板 1 1 0 A、第 2 基板 1 1 0 B 及び第 3 基板 1 1 0 C の信号線及び電源線の各々は互いに電氣的に接続され得る。

[0280] さらに、図 1 9 E に示すように、固体撮像装置 1 9 D の構造に対して、パッド 1 5 1 は、第 1 基板 1 1 0 A の裏面側に設けられ、引き出し線開口部 1

55の内壁に成膜された導電材料層510によって第1基板110Aの多層配線層105内の配線と電氣的に接続してもよい。具体的には、引き出し線開口部155は、第1基板110Aの裏面側から半導体基板101を貫通し、第1基板110Aの多層配線層105内の配線を露出させるように形成される。また、引き出し線開口部155の内壁には、タングステン(W)などで形成された導電材料層510が成膜され、導電材料層510は、第1基板110Aの裏面側の絶縁膜109の上まで延伸される。さらに、第1基板110Aの裏面側の絶縁膜109の上に延伸された導電材料層510の上には、パッド151が設けられる。すなわち、パッド151は、第1基板110Aの裏面上に設けられ、導電材料層510を介して各基板の多層配線層105、125、135内の配線と電氣的に接続してもよい。

[0281] さらに、図19Fに示すように、固体撮像装置19Eの構造に対して、パッド151は、絶縁膜109の内部に埋め込まれて形成されてもよい。

[0282] なお、図19A～図19Fで示した固体撮像装置19A～19Fにおいて、パッド151は、1つの引き出し線開口部155に対して複数設けられてもよい。また、TSV157a、157bは、パッド151と同様の第2の金属によって形成される配線に接続してもよく、通常の配線と同様の第1の金属によって形成される配線に接続してもよい。

[0283] (4-15. 第15の構成例)

続いて、図20A～図20Eを参照して、第15の構成例に係る固体撮像装置20A～20Eについて説明する。図20A～図20Eは、第15の構成例に係る固体撮像装置20A～20Eの一例を示す縦断面図である。

[0284] 第15の構成例に係る固体撮像装置20A～20Eでは、第1基板110Aの信号線及び電源線と、第2基板110Bの信号線及び電源線とを電氣的に接続するツインコンタクト構造のTSV157aに加えて、第1基板110Aの裏面側から第1基板110A及び第2基板110Bを貫通して設けられた1つの貫通孔に導電材料が埋め込まれたシェアドコンタクト構造のTSV157bがさらに設けられる。

[0285] 具体的には、図20Aに示すように、TSV157aは、第3基板110Cの裏面側から第3基板110C及び第2基板110Bを貫通し、第1基板110Aの多層配線層105内の配線を露出させる第1の貫通孔と、第3基板110Cの裏面側から第3基板110Cを貫通し、第2基板110Bの多層配線層125内の配線を露出させる第2の貫通孔とに導電材料が埋め込まれた構造にて設けられる。TSV157bは、第1基板110Aの裏面側から第1基板110A及び第2基板110Bを貫通して設けられ、第2基板110Bの多層配線層125内の配線と接触して、第3基板110Cの多層配線層135内の配線を露出させる1つの貫通孔に導電材料が埋め込まれた構造にて設けられる。これにより、固体撮像装置20Aでは、TSV157a、157bを介して、第1基板110A、第2基板110B及び第3基板110Cの信号線及び電源線の各々が互いに電氣的に接続される。また、パッド151は、第1基板110Aの多層配線層105、第2基板110Bの多層配線層125、又は第3基板110Cの多層配線層135のいずれかの内部に設けられていればよい。

[0286] また、図20Bに示すように、固体撮像装置20Aの構造に対して、第1基板110Aの裏面側には導電材料層510が設けられ、導電材料層510の上にはパッド151が設けられてもよい。導電材料層510が第1基板110Aの裏面側に露出したTSV157bの上に延伸されるように設けられることで、外部回路との接点となるパッド151は、TSV157a、157bを介して、第1基板110A、第2基板110B及び第3基板110Cの信号線及び電源線の各々と互いに電氣的に接続することができる。

[0287] さらに、図20Cに示すように、固体撮像装置20Bの構造に対して、パッド151は、絶縁膜109の内部に埋め込まれて形成されてもよい。

[0288] また、図20Dに示すように、固体撮像装置20Bの構造に対して、TSV157bは、貫通孔に導電材料が埋め込まれた構造に替えて、貫通孔の内壁に導電材料が成膜された構造にて設けられてもよい。具体的には、TSV157bの貫通孔（すなわち、引き出し線開口部155）に導電材料層51

0が成膜され、導電材料層510によって、第2基板110Bの多層配線層125内の配線、及び第3基板110Cの多層配線層135内の配線は、電氣的に接続される。このような場合、TSV157bは、引き出し線開口部155の内壁に成膜された導電材料層510によって、パッド151と、各基板の多層配線層内の配線とを電氣的に接続するパッド引き出し構造と類似した構造を取り得る。よって、TSV157bは、パッド引き出し構造の機能を兼ねることも可能である。

[0289] さらに、図20Eに示すように、固体撮像装置20Dの構造に対して、パッド151は、絶縁膜109の内部に埋め込まれて形成されてもよい。

[0290] なお、図20A～図20Eで示した固体撮像装置20A～20Eにおいて、パッド151は、1つの引き出し線開口部155に対して複数設けられてもよい。また、TSV157a、157bは、パッド151と同様の第2の金属によって形成される配線に接続してもよく、通常の配線と同様の第1の金属によって形成される配線に接続してもよい。

[0291] (4-16. 第16の構成例)

次に、図21A～図21Cを参照して、第16の構成例に係る固体撮像装置21A～21Cについて説明する。図21A～図21Cは、第16の構成例に係る固体撮像装置21A～21Cの一例を示す縦断面図である。

[0292] 第16の構成例に係る固体撮像装置21A～21Cでは、第1基板110Aの信号線及び電源線と、第2基板110Bの信号線及び電源線とを電氣的に接続するツインコンタクト構造のTSV157に加えて、第2基板110B及び第3基板110Cの貼り合わせ面に、互いの電極が直接接触する状態で接合された電極接合構造159がさらに設けられる。

[0293] 具体的には、図21Aに示すように、電極接合構造159は、第2基板110Bの多層配線層125の最上層に形成された電極と、第3基板110Cの多層配線層135の最上層に形成された電極とが直接接触した状態で接合されることで形成される。また、TSV157は、第3基板110Cの裏面側から第3基板110C及び第2基板110Bを貫通し、第1基板110A

の多層配線層 105 内の配線を露出させる第 1 の貫通孔と、第 3 基板 110C の裏面側から第 3 基板 110C を貫通し、第 2 基板 110B の多層配線層 125 内の配線を露出させる第 2 の貫通孔とに導電材料が埋め込まれた構造にて設けられる。これにより、固体撮像装置 21A では、TSV157 及び電極接合構造 159 を介して、第 1 基板 110A、第 2 基板 110B 及び第 3 基板 110C の信号線及び電源線の各々が互いに電氣的に接続される。また、パッド 151 は、第 1 基板 110A の多層配線層 105、第 2 基板 110B の多層配線層 125、又は第 3 基板 110C の多層配線層 135 のいずれかの内部に設けられていればよい。

[0294] また、図 21B に示すように、パッド 151 は、第 1 基板 110A の裏面側に設けられ、引き出し線開口部 155 の内壁に成膜された導電材料層 510 によって第 1 基板 110A の多層配線層 105 内の配線と電氣的に接続してもよい。具体的には、引き出し線開口部 155 は、第 1 基板 110A の裏面側から半導体基板 101 を貫通し、第 1 基板 110A の多層配線層 105 内の配線を露出させるように形成される。また、引き出し線開口部 155 の内壁には、タングステン (W) などで形成された導電材料層 510 が成膜され、導電材料層 510 は、第 1 基板 110A の裏面側の絶縁膜 109 の上まで延伸される。さらに、第 1 基板 110A の裏面側の絶縁膜 109 の上に延伸された導電材料層 510 の上には、パッド 151 が設けられる。すなわち、パッド 151 は、第 1 基板 110A の裏面上に設けられ、導電材料層 510 を介して各基板の多層配線層 105、125、135 内の配線と電氣的に接続してもよい。

[0295] さらに、図 21C に示すように、固体撮像装置 21B の構造に対して、パッド 151 は、絶縁膜 109 の内部に埋め込まれて形成されてもよい。

[0296] なお、図 21A～図 21C で示した固体撮像装置 21A～21C において、パッド 151 は、1 つの引き出し線開口部 155 に対して複数設けられてもよい。また、TSV157 は、パッド 151 と同様の第 2 の金属によって形成される配線に接続してもよく、通常の配線と同様の第 1 の金属によって

形成される配線に接続してもよい。

[0297] (4-17. 第17の構成例)

続いて、図22A～図22Fを参照して、第17の構成例に係る固体撮像装置22A～22Fについて説明する。図22A～図22Fは、第17の構成例に係る固体撮像装置22A～22Fの一例を示す縦断面図である。

[0298] 第17の構成例に係る固体撮像装置22A～22Fでは、第1基板110Aの信号線及び電源線と、第2基板110Bの信号線及び電源線とを電氣的に接続するツインコンタクト構造のTSV157aに加えて、第2基板110Bの多層配線層125内の配線を露出させる第1の貫通孔と、第3基板110Cの多層配線層135内の配線を露出させる第2の貫通孔とに導電材料が埋め込まれたツインコンタクト構造のTSV157bがさらに設けられ、第2基板110B及び第3基板110Cの貼り合わせ面に、互いの電極が直接接触する状態で接合された電極接合構造159がさらに設けられる。

[0299] 具体的には、図22Aに示すように、TSV157aは、第3基板110Cの裏面側から第3基板110C及び第2基板110Bを貫通し、第1基板110Aの多層配線層105内の配線を露出させる第1の貫通孔と、第3基板110Cの裏面側から第3基板110Cを貫通し、第2基板110Bの多層配線層125内の配線を露出させる第2の貫通孔とに導電材料が埋め込まれた構造にて設けられる。TSV157bは、第3基板110Cの裏面側から第3基板110Cを貫通し、第2基板110Bの多層配線層125内の配線を露出させる第1の貫通孔と、第3基板110Cの裏面側から半導体基板131を貫通し、第3基板110Cの多層配線層135内の配線を露出させる第2の貫通孔とに導電材料が埋め込まれた構造にて設けられる。また、電極接合構造159は、第2基板110Bの多層配線層125の最上層に設けられた電極と、第3基板110Cの多層配線層135の最上層に設けられた電極とを直接接触した状態で接合することで形成される。これにより、固体撮像装置22Aでは、TSV157a、157b及び電極接合構造159を介して、第1基板110A、第2基板110B及び第3基板110Cの信号

線及び電源線の各々が互いに電氣的に接続される。また、パッド151は、第1基板110Aの多層配線層105、第2基板110Bの多層配線層125、又は第3基板110Cの多層配線層135のいずれかの内部に設けられていけばよい。

[0300] また、図22Bに示すように、パッド151は、第1基板110Aの裏面側に設けられ、引き出し線開口部155の内壁に成膜された導電材料層510によって第1基板110Aの多層配線層105内の配線と電氣的に接続してもよい。具体的には、引き出し線開口部155は、第1基板110Aの裏面側から半導体基板101を貫通し、第1基板110Aの多層配線層105内の配線を露出させるように形成される。また、引き出し線開口部155の内壁には、タングステン(W)などで形成された導電材料層510が成膜され、導電材料層510は、第1基板110Aの裏面側の絶縁膜109の上まで延伸される。さらに、第1基板110Aの裏面側の絶縁膜109の上に延伸された導電材料層510の上には、パッド151が設けられる。すなわち、パッド151は、第1基板110Aの裏面上に設けられ、導電材料層510を介して各基板の多層配線層105、125、135内の配線と電氣的に接続してもよい。

[0301] さらに、図22Cに示すように、固体撮像装置22Bの構造に対して、パッド151は、絶縁膜109の内部に埋め込まれて形成されてもよい。

[0302] また、図22Dに示すように、TSV157bは、第2基板110Bの裏面側から第2基板110Bを貫通して設けられてもよい。具体的には、TSV157bは、第2基板110Bの裏面側から半導体基板121を貫通し、第2基板110Bの多層配線層125内の配線を露出させる第1の貫通孔と、第2基板110Bの裏面側から第2基板110Bを貫通し、第3基板110Cの多層配線層135内の配線を露出させる第2の貫通孔とに導電材料が埋め込まれた構造にて設けられてもよい。これによっても、TSV157bは、第2基板110Bの配線及び第3基板110Cの配線を電氣的に接続することができるため、第1基板110A、第2基板110B及び第3基板1

10Cの信号線及び電源線の各々は互いに電氣的に接続され得る。

[0303] また、図22Eに示すように、固体撮像装置22Dに対して、パッド151は、第1基板110Aの裏面側に設けられ、引き出し線開口部155の内壁に成膜された導電材料層510によって第1基板110Aの多層配線層105内の配線と電氣的に接続してもよい。具体的には、引き出し線開口部155は、第1基板110Aの裏面側から半導体基板101を貫通し、第1基板110Aの多層配線層105内の配線を露出させるように形成される。また、引き出し線開口部155の内壁には、タングステン(W)などで形成された導電材料層510が成膜され、導電材料層510は、第1基板110Aの裏面側の絶縁膜109の上まで延伸される。さらに、第1基板110Aの裏面側の絶縁膜109の上に延伸された導電材料層510の上には、パッド151が設けられる。すなわち、パッド151は、第1基板110Aの裏面上に設けられ、導電材料層510を介して各基板の多層配線層105、125、135内の配線と電氣的に接続してもよい。

[0304] さらに、図22Fに示すように、固体撮像装置22Eの構造に対して、パッド151は、絶縁膜109の内部に埋め込まれて形成されてもよい。

[0305] なお、図22A～図22Fで示した固体撮像装置22A～22Fにおいて、パッド151は、1つの引き出し線開口部155に対して複数設けられてもよい。また、TSV157は、パッド151と同様の第2の金属によって形成される配線に接続してもよく、通常の配線と同様の第1の金属によって形成される配線に接続してもよい。

[0306] (4-18. 第18の構成例)

次に、図23A～図23Eを参照して、第18の構成例に係る固体撮像装置23A～23Eについて説明する。図23A～図23Eは、第18の構成例に係る固体撮像装置23A～23Eの一例を示す縦断面図である。

[0307] 第18の構成例に係る固体撮像装置23A～23Eでは、第1基板110Aの信号線及び電源線と、第2基板110Bの信号線及び電源線とを電氣的に接続するツインコンタクト構造のTSV157aに加えて、第1基板11

0 Aの裏面側から第2基板110 Bの多層配線層125内の配線を露出させる第1の貫通孔と、第1基板110 Aの裏面側から第3基板110 Cの多層配線層135内の配線を露出させる第2の貫通孔とに導電材料が埋め込まれたツインコンタクト構造のTSV157 bがさらに設けられ、第2基板110 B及び第3基板110 Cの貼り合わせ面に、互いの電極が直接接触する状態で接合された電極接合構造159がさらに設けられる。

[0308] 具体的には、図23 Aに示すように、TSV157 aは、第3基板110 Cの裏面側から第3基板110 C及び第2基板110 Bを貫通し、第1基板110 Aの多層配線層105内の配線を露出させる第1の貫通孔と、第3基板110 Cの裏面側から第3基板110 Cを貫通し、第2基板110 Bの多層配線層125内の配線を露出させる第2の貫通孔とに導電材料が埋め込まれた構造にて設けられる。TSV157 bは、第1基板110 Aの裏面側から第1基板110 A及び第2基板110 Bを貫通して設けられ、第1基板110 Aの裏面側から第1基板110 Aを貫通し、第2基板110 Bの多層配線層125内の配線を露出させる第1の貫通孔と、第1基板110 Aの裏面側から第1基板110 A及び第2基板110 Bを貫通し、第3基板110 Cの多層配線層135内の配線を露出させる第2の貫通孔とに導電材料が埋め込まれた構造にて設けられる。また、電極接合構造159は、第2基板110 Bの多層配線層125の最上層に設けられた電極と、第3基板110 Cの多層配線層135の最上層に設けられた電極とを直接接触した状態で接合することで形成される。これにより、固体撮像装置23 Aでは、TSV157 a、157 b及び電極接合構造159を介して、第1基板110 A、第2基板110 B及び第3基板110 Cの信号線及び電源線の各々が互いに電氣的に接続される。また、パッド151は、第1基板110 Aの多層配線層105、第2基板110 Bの多層配線層125、又は第3基板110 Cの多層配線層135のいずれかの内部に設けられていればよい。

[0309] また、図23 Bに示すように、固体撮像装置23 Aの構造に対して、第1基板110 Aの裏面側には導電材料層510が設けられ、導電材料層510

の上にはパッド151が設けられてもよい。導電材料層510が第1基板110Aの裏面側に露出したTSV157bの上に延伸されるように設けられることで、外部回路との接点となるパッド151は、TSV157a、157b、及び電極接合構造159を介して、第1基板110A、第2基板110B及び第3基板110Cの信号線及び電源線の各々と互いに電氣的に接続することができる。

[0310] さらに、図23Cに示すように、固体撮像装置23Bの構造に対して、パッド151は、絶縁膜109の内部に埋め込まれて形成されてもよい。

[0311] また、図23Dに示すように、TSV157bは、第1の貫通孔及び第2の貫通孔に導電材料が埋め込まれた構造に替えて、第1の貫通孔及び第2の貫通孔の内壁に導電材料が成膜された構造にて設けられてもよい。具体的には、TSV157bの第1の貫通孔及び第2の貫通孔（すなわち、引き出し線開口部155a、155b）に導電材料層510が成膜され、導電材料層510によって、第2基板110Bの多層配線層125内の配線、及び第3基板110Cの多層配線層135内の配線は、電氣的に接続される。このような場合、TSV157bは、引き出し線開口部155a、155bの内壁に成膜された導電材料層510によって、パッド151と、各基板の多層配線層内の配線とを電氣的に接続するパッド引き出し構造と類似した構造を取り得る。よって、TSV157bは、パッド引き出し構造の機能を兼ねることも可能である。

[0312] さらに、図23Eに示すように、固体撮像装置23Dの構造に対して、パッド151は、絶縁膜109の内部に埋め込まれて形成されてもよい。

[0313] なお、図23A～図23Eで示した固体撮像装置23A～23Eにおいて、導電材料層510は、引き出し線開口部155a、155bごとに電氣的に離隔されて設けられてもよい。また、パッド151は、引き出し線開口部155a、155bごとに設けられていてもよく、1つの引き出し線開口部155a、155bにつき複数設けられてもよい。また、TSV157a、157bは、パッド151と同様の第2の金属によって形成される配線に接

続してもよく、通常の配線と同様の第1の金属によって形成される配線に接続してもよい。

[0314] (4-19. 第19の構成例)

続いて、図24A～図24Fを参照して、第19の構成例に係る固体撮像装置24A～24Fについて説明する。図24A～図24Fは、第19の構成例に係る固体撮像装置24A～24Fの一例を示す縦断面図である。

[0315] 第19の構成例に係る固体撮像装置24A～24Fでは、第1基板110Aの信号線及び電源線と、第2基板110Bの信号線及び電源線とを電氣的に接続するツインコンタクト構造のTSV157aに加えて、第2基板110Bの多層配線層125内の配線、及び第3基板110Cの多層配線層135内の配線と接続し、1つの貫通孔に導電材料が埋め込まれたシェアードコンタクト構造のTSV157bがさらに設けられ、第2基板110B及び第3基板110Cの貼り合わせ面に設けられた互いの電極を接触状態で接合した電極接合構造159がさらに設けられる。

[0316] 具体的には、図24Aに示すように、TSV157aは、第3基板110Cの裏面側から第3基板110C及び第2基板110Bを貫通し、第1基板110Aの多層配線層105内の配線を露出させる第1の貫通孔と、第3基板110Cの裏面側から第3基板110Cを貫通し、第2基板110Bの多層配線層125内の配線を露出させる第2の貫通孔とに導電材料が埋め込まれた構造にて設けられる。TSV157bは、第3基板110Cの裏面側から第3基板110Cを貫通して設けられ、第3基板110Cの多層配線層135内の配線と接触して第2基板110Bの多層配線層125内の配線を露出させる1つの貫通孔に導電材料が埋め込まれた構造にて設けられる。また、電極接合構造159は、第2基板110Bの多層配線層125の最上層に設けられた電極と、第3基板110Cの多層配線層135の最上層に設けられた電極とを直接接触した状態で接合することで形成される。これにより、固体撮像装置24Aでは、TSV157a、157b及び電極接合構造159を介して、第1基板110A、第2基板110B及び第3基板110Cの

信号線及び電源線の各々が互いに電氣的に接続される。また、パッド151は、第1基板110Aの多層配線層105、第2基板110Bの多層配線層125、又は第3基板110Cの多層配線層135のいずれかの内部に設けられていればよい。

[0317] また、図24Bに示すように、パッド151は、第1基板110Aの裏面側に設けられ、引き出し線開口部155の内壁に成膜された導電材料層510によって第1基板110Aの多層配線層105内の配線と電氣的に接続してもよい。具体的には、引き出し線開口部155は、第1基板110Aの裏面側から半導体基板101を貫通し、第1基板110Aの多層配線層105内の配線を露出させるように形成される。また、引き出し線開口部155の内壁には、タングステン(W)などで形成された導電材料層510が成膜され、導電材料層510は、第1基板110Aの裏面側の絶縁膜109の上まで延伸される。さらに、第1基板110Aの裏面側の絶縁膜109の上に延伸された導電材料層510の上には、パッド151が設けられる。これにより、パッド151は、導電材料層510を介して第1基板110Aの多層配線層105内の配線と電氣的に接続することができる。

[0318] さらに、図24Cに示すように、固体撮像装置24Bの構造に対して、パッド151は、絶縁膜109の内部に埋め込まれて形成されてもよい。

[0319] また、図24Dに示すように、TSV157bは、第2基板110Bの裏面側から第2基板110Bを貫通して設けられてもよい。具体的には、TSV157bは、第2基板110Bの裏面側から第2基板110Bを貫通し、第2基板110Bの多層配線層125内の配線と接触して第3基板110Cの多層配線層135内の配線を露出させる1つの貫通孔に導電材料が埋め込まれた構造にて設けられてもよい。これによっても、TSV157bは、第2基板110Bの配線及び第3基板110Cの配線を電氣的に接続することができるため、第1基板110A、第2基板110B及び第3基板110Cの信号線及び電源線の各々は互いに電氣的に接続され得る。

[0320] また、図24Eに示すように、固体撮像装置24Dの構造に対して、パッ

ド１５１は、第１基板１１０Ａの裏面側に設けられ、引き出し線開口部１５５の内壁に成膜された導電材料層５１０によって第１基板１１０Ａの多層配線層１０５内の配線と電氣的に接続してもよい。具体的には、引き出し線開口部１５５は、第１基板１１０Ａの裏面側から半導体基板１０１を貫通し、第１基板１１０Ａの多層配線層１０５内の配線を露出させるように形成される。また、引き出し線開口部１５５の内壁には、タングステン（Ｗ）などで形成された導電材料層５１０が成膜され、導電材料層５１０は、第１基板１１０Ａの裏面側の絶縁膜１０９の上まで延伸される。さらに、第１基板１１０Ａの裏面側の絶縁膜１０９の上に延伸された導電材料層５１０の上には、パッド１５１が設けられる。これにより、パッド１５１は、導電材料層５１０を介して第１基板１１０Ａの多層配線層１０５内の配線と電氣的に接続することができる。

[0321] さらに、図２４Ｆに示すように、固体撮像装置２４Ｅの構造に対して、パッド１５１は、絶縁膜１０９の内部に埋め込まれて形成されてもよい。

[0322] なお、図２４Ａ～図２４Ｆで示した固体撮像装置２４Ａ～２４Ｆにおいて、導電材料層５１０は、引き出し線開口部１５５ａ、１５５ｂごとに電氣的に離隔されて設けられてもよい。また、パッド１５１は、引き出し線開口部１５５ａ、１５５ｂごとに設けられていてもよく、１つの引き出し線開口部１５５ａ、１５５ｂにつき複数設けられてもよい。また、ＴＳＶ１５７ａ、１５７ｂは、パッド１５１と同様の第２の金属によって形成される配線に接続してもよく、通常の配線と同様の第１の金属によって形成される配線に接続してもよい。

[0323] （４－２０．第２０の構成例）

次に、図２５Ａ～図２５Ｅを参照して、第２０の構成例に係る固体撮像装置２５Ａ～２５Ｅについて説明する。図２５Ａ～図２５Ｅは、第２０の構成例に係る固体撮像装置２５Ａ～２５Ｅの一例を示す縦断面図である。

[0324] 第２０の構成例に係る固体撮像装置２５Ａ～２５Ｅでは、第１基板１１０Ａの信号線及び電源線と、第２基板１１０Ｂの信号線及び電源線とを電氣的

に接続するツインコンタクト構造のTSV157aに加えて、第2基板110Bの多層配線層125内の配線、及び第3基板110Cの多層配線層135内の配線と接続し、第1基板110Aの裏面側から第1基板110A及び第2基板110Bを貫通して設けられた1つの貫通孔に導電材料が埋め込まれたシェアードコンタクト構造のTSV157bがさらに設けられ、第2基板110B及び第3基板110Cの貼り合わせ面に設けられた互いの電極を接触状態で接合した電極接合構造159がさらに設けられる。

[0325] 具体的には、図25Aに示すように、TSV157aは、第3基板110Cの裏面側から第3基板110C及び第2基板110Bを貫通し、第1基板110Aの多層配線層105内の配線を露出させる第1の貫通孔と、第3基板110Cの裏面側から第3基板110Cを貫通し、第2基板110Bの多層配線層125内の配線を露出させる第2の貫通孔とに導電材料が埋め込まれた構造にて設けられる。TSV157bは、第1基板110Aの裏面側から第1基板110A及び第2基板110Bを貫通して設けられ、第2基板110Bの多層配線層125内の配線と接触して、第3基板110Cの多層配線層135内の配線を露出させる1つの貫通孔に導電材料が埋め込まれた構造にて設けられる。また、電極接合構造159は、第2基板110Bの多層配線層125の最上層に設けられた電極と、第3基板110Cの多層配線層135の最上層に設けられた電極とを直接接触した状態で接合することで形成される。これにより、固体撮像装置25Aでは、TSV157a、157b及び電極接合構造159を介して、第1基板110A、第2基板110B及び第3基板110Cの信号線及び電源線の各々が互いに電氣的に接続される。また、パッド151は、第1基板110Aの多層配線層105、第2基板110Bの多層配線層125、又は第3基板110Cの多層配線層135のいずれかの内部に設けられていけばよい。

[0326] また、図25Bに示すように、固体撮像装置25Aの構造に対して、第1基板110Aの裏面側には導電材料層510が設けられ、導電材料層510の上にはパッド151が設けられてもよい。導電材料層510が第1基板1

10Aの裏面側に露出したTSV157bの上に延伸されるように設けられることで、外部回路との接点となるパッド151は、TSV157a、157b、及び電極接合構造159を介して、第1基板110A、第2基板110B及び第3基板110Cの信号線及び電源線の各々と互いに電氣的に接続することができる。

[0327] さらに、図25Cに示すように、固体撮像装置25Bの構造に対して、パッド151は、絶縁膜109の内部に埋め込まれて形成されてもよい。

[0328] また、図25Dに示すように、TSV157bは、貫通孔に導電材料が埋め込まれた構造に替えて、貫通孔の内壁に導電材料が成膜された構造にて設けられてもよい。具体的には、TSV157bの貫通孔（すなわち、引き出し線開口部155）に導電材料層510が成膜され、導電材料層510によって、第2基板110Bの多層配線層125内の配線、及び第3基板110Cの多層配線層135内の配線は、電氣的に接続される。このような場合、TSV157bは、引き出し線開口部155の内壁に成膜された導電材料層510によって、パッド151と、各基板の多層配線層内の配線とを電氣的に接続するパッド引き出し構造と類似した構造を取り得る。よって、TSV157bは、パッド引き出し構造の機能を兼ねることも可能である。

[0329] さらに、図25Eに示すように、固体撮像装置25Dの構造に対して、パッド151は、絶縁膜109の内部に埋め込まれて形成されてもよい。

[0330] なお、図25A～図25Eで示した固体撮像装置25A～25Eにおいて、パッド151は、1つの引き出し線開口部155に対して複数設けられてもよい。また、TSV157は、パッド151と同様の第2の金属によって形成される配線に接続してもよく、通常の配線と同様の第1の金属によって形成される配線に接続してもよい。

[0331] （5. 適用例）

（電子機器への応用）

以上説明した本実施形態に係る固体撮像装置1～25Eの適用例について説明する。ここでは、固体撮像装置1～25Eが適用され得る電子機器のい

くつかの例について説明する。

[0332] 図26Aは、本実施形態に係る固体撮像装置1～25Eが適用され得る電子機器の一例である、スマートフォンの外観を示す図である。図26Aに示すように、スマートフォン901は、ボタンから構成されユーザによる操作入力を受け付ける操作部903と、各種の情報を表示する表示部905と、筐体内に設けられ、観察対象を電子的に撮影する撮像部（図示せず）と、を有する。当該撮像部が、固体撮像装置1～25Eによって構成され得る。

[0333] 図26B及び図26Cは、本実施形態に係る固体撮像装置1～25Eが適用され得る電子機器の他の例である、デジタルカメラの外観を示す図である。図26Bは、デジタルカメラ911を前方（被写体側）から眺めた外観を示しており、図26Cは、デジタルカメラ911を後方から眺めた外観を示している。図26B及び図26Cに示すように、デジタルカメラ911は、本体部（カメラボディ）913と、交換式のレンズユニット915と、撮影時にユーザによって把持されるグリップ部917と、各種の情報を表示するモニタ919と、撮影時にユーザによって観察されるスルー画を表示するEVF921と、筐体内に設けられ、観察対象を電子的に撮影する撮像部（図示せず）と、を有する。当該撮像部が、固体撮像装置1～25Eによって構成され得る。

[0334] 以上、本実施形態に係る固体撮像装置1～25Eが適用され得る電子機器のいくつかの例について説明した。なお、固体撮像装置1～25Eが適用され得る電子機器は上記で例示したものに限定されず、当該固体撮像装置1～25Eは、ビデオカメラ、眼鏡型のウェアラブルデバイス、HMD（Head Mounted Display）、タブレットPC、又はゲーム機器等、あらゆる電子機器に搭載される撮像部として適用することが可能である。

[0335] （固体撮像装置の他の構造への応用）

なお、本開示に係る技術は、図27Aで示す固体撮像装置に適用されてもよい。図27Aは、本開示に係る技術を適用し得る固体撮像装置の構成例を示す断面図である。

[0336] 固体撮像装置では、PD（フォトダイオード）20019が、半導体基板20018の裏面（図では上面）側から入射する入射光20001を受光する。PD20019の上方には、平坦化膜20013、CF（カラーフィルタ）20012、マイクロレンズ20011が設けられており、各部を順次介して入射した入射光20001を、受光面20017で受光して光電変換が行われる。

[0337] 例えば、PD20019は、n型半導体領域20020が、電荷（電子）を蓄積する電荷蓄積領域として形成されている。PD20019においては、n型半導体領域20020は、半導体基板20018のp型半導体領域20016、20041の内部に設けられている。n型半導体領域20020の、半導体基板20018の表面（下面）側には、裏面（上面）側よりも不純物濃度が高いp型半導体領域20041が設けられている。つまり、PD20019は、HAD（Hole-Accumulation Diode）構造になっており、n型半導体領域20020の上面側と下面側との各界面において、暗電流が発生することを抑制するように、p型半導体領域20016、20041が形成されている。

[0338] 半導体基板20018の内部には、複数の画素20010の間を電氣的に分離する画素分離部20030が設けられており、この画素分離部20030で区画された領域に、PD20019が設けられている。図中、上面側から、固体撮像装置を見た場合、画素分離部20030は、例えば、複数の画素20010の間に介在するように格子状に形成されており、PD20019は、この画素分離部20030で区画された領域内に形成されている。

[0339] 各PD20019では、アノードが接地されており、固体撮像装置において、PD20019が蓄積した信号電荷（例えば、電子）は、図示せぬ転送Tr（MOS FET）等を介して読み出され、電気信号として、図示せぬVSL（垂直信号線）へ出力される。

[0340] 配線層20050は、半導体基板20018のうち、遮光膜20014、CF20012、マイクロレンズ20011等の各部が設けられた裏面（上

面)とは反対側の表面(下面)に設けられている。

[0341] 配線層20050は、配線20051と絶縁層20052とを含み、絶縁層20052内において、配線20051が各素子に電氣的に接続するように形成されている。配線層20050は、いわゆる多層配線の層になっており、絶縁層20052を構成する層間絶縁膜と配線20051とが交互に複数回積層されて形成されている。ここでは、配線20051としては、転送Tr等のPD20019から電荷を読み出すためのTrへの配線や、VSL等の各配線が、絶縁層20052を介して積層されている。

[0342] 配線層20050の、PD20019が設けられている側に対して反対側の面には、支持基板20061が設けられている。例えば、厚みが数百 μ mのシリコン半導体からなる基板が、支持基板20061として設けられている。

[0343] 遮光膜20014は、半導体基板20018の裏面(図では上面)の側に設けられている。

[0344] 遮光膜20014は、半導体基板20018の上方から半導体基板20018の裏面へ向かう入射光20001の一部を、遮光するように構成されている。

[0345] 遮光膜20014は、半導体基板20018の内部に設けられた画素分離部20030の上方に設けられている。ここでは、遮光膜20014は、半導体基板20018の裏面(上面)上において、シリコン酸化膜等の絶縁膜20015を介して、凸形状に突き出るように設けられている。これに対して、半導体基板20018の内部に設けられたPD20019の上方においては、PD20019に入射光20001が入射するように、遮光膜20014は、設けられておらず、開口している。

[0346] つまり、図中、上面側から、固体撮像装置を見た場合、遮光膜20014の平面形状は、格子状になっており、入射光20001が受光面20017へ通過する開口が形成されている。

[0347] 遮光膜20014は、光を遮光する遮光材料で形成されている。例えば、

チタン (Ti) 膜とタングステン (W) 膜とを、順次、積層することで、遮光膜 20014 が形成されている。この他に、遮光膜 20014 は、例えば、窒化チタン (TiN) 膜とタングステン (W) 膜とを、順次、積層することで形成することができる。

[0348] 遮光膜 20014 は、平坦化膜 20013 によって被覆されている。平坦化膜 20013 は、光を透過する絶縁材料を用いて形成されている。

[0349] 画素分離部 20030 は、溝部 20031、固定電荷膜 20032、及び、絶縁膜 20033 を有する。

[0350] 固定電荷膜 20032 は、半導体基板 20018 の裏面 (上面) の側において、複数の画素 20010 の間を区画している溝部 20031 を覆うように形成されている。

[0351] 具体的には、固定電荷膜 20032 は、半導体基板 20018 において裏面 (上面) 側に形成された溝部 20031 の内側の面を一定の厚みで被覆するように設けられている。そして、その固定電荷膜 20032 で被覆された溝部 20031 の内部を埋め込むように、絶縁膜 20033 が設けられている (充填されている)。

[0352] ここでは、固定電荷膜 20032 は、半導体基板 20018 との界面部分において正電荷 (ホール) 蓄積領域が形成されて暗電流の発生が抑制されるように、負の固定電荷を有する高誘電体を用いて形成されている。固定電荷膜 20032 が負の固定電荷を有するように形成されていることで、その負の固定電荷によって、半導体基板 20018 との界面に電界が加わり、正電荷 (ホール) 蓄積領域が形成される。

[0353] 固定電荷膜 20032 は、例えば、ハフニウム酸化膜 (HfO_2 膜) で形成することができる。また、固定電荷膜 20032 は、その他、例えば、ハフニウム、ジルコニウム、アルミニウム、タンタル、チタン、マグネシウム、イットリウム、ランタノイド元素等の酸化物の少なくとも 1 つを含むように形成することができる。

[0354] また、本開示に係る技術は、図 27B で示す固体撮像装置に適用されても

よい。図27Bは、本開示に係る技術が適用され得る固体撮像装置の概略構成を示す。

[0355] 固体撮像装置30001は、複数の画素30002が規則性をもって2次元配列された撮像部（いわゆる画素部）30003と、撮像部30003の周辺に配置された周辺回路、すなわち垂直駆動部30004、水平転送部30005及び出力部30006とを有して構成される。画素30002は、1つの光電変換素子であるフォトダイオード30021と、複数の画素トランジスタ（MOSトランジスタ）Tr1、Tr2、Tr3、Tr4とにより構成される。

[0356] フォトダイオード30021は、光入射で光電変換され、その光電変換で生成された信号電荷を蓄積する領域を有して成る。複数の画素トランジスタは、本例では転送トランジスタTr1、リセットトランジスタTr2、増幅トランジスタTr3及び選択トランジスタTr4の4つのMOSトランジスタを有している。転送トランジスタTr1は、フォトダイオード30021に蓄積された信号電荷を後述するフローティングディフュージョン（FD）領域30022に読み出すトランジスタである。リセットトランジスタTr2は、FD領域30022の電位を規定の値に設定するためのトランジスタである。増幅トランジスタTr3は、FD領域30022に読み出された信号電荷を電氣的に増幅するためのトランジスタである。選択トランジスタTr4は、画素1行を選択して画素信号を垂直信号線30008に読み出すためのトランジスタである。

[0357] なお、図示しないが、選択トランジスタTr4を省略した3トランジスタとフォトダイオードPDで画素を構成することも可能である。

[0358] 画素30002の回路構成では、転送トランジスタTr1のソースがフォトダイオード30021に接続され、そのドレインがリセットトランジスタTr2のソースに接続される。転送トランジスタTr1とリセットトランジスタTr2間の電荷－電圧変換手段となるFD領域30022（転送トランジスタのドレイン領域、リセットトランジスタのソース領域に相当する）が

増幅トランジスタ T_r3 のゲートに接続される。増幅トランジスタ T_r3 のソースは選択トランジスタ T_r4 のドレインに接続される。リセットトランジスタ T_r2 のドレイン及び増幅トランジスタ T_r3 のドレインは、電源電圧供給部に接続される。また、選択トランジスタ T_r4 のソースが垂直信号線 30008 に接続される。

[0359] 垂直駆動部 30004 からは、1 行に配列された画素のリセットトランジスタ T_r2 のゲートに共通に印加される行リセット信号 ϕRST が、同じく 1 行の画素の転送トランジスタ T_r1 のゲートに共通に印加される行転送信号 ϕTRG が、同じく 1 行の選択トランジスタ T_r4 のゲートに共通に印加される行選択信号 ϕSEL が、それぞれ供給されるようになされる。

[0360] 水平転送部 30005 は、各列の垂直信号線 30008 に接続された増幅器またはアナログ／デジタル変換器 (ADC)、本例ではアナログ／デジタル変換器 30009 と、列選択回路 (スイッチ手段) 30007 と、水平転送線 (例えばデータビット線と同数の配線で構成されたバス配線) 30010 とを有して構成される。出力部 30006 は、増幅器又は、アナログ／デジタル変換器及び／又は信号処理回路、本例では水平転送線 30010 からの出力を処理する信号処理回路 30011 と、出力バッファ 30012 とを有して構成される。

[0361] この固体撮像装置 30001 では、各行の画素 30002 の信号が各アナログ／デジタル変換器 30009 にてアナログ／デジタル変換され、順次選択される列選択回路 30007 を通じて水平転送線 30010 に読み出され、順次に水平転送される。水平転送線 30010 に読み出された画像データは、信号処理回路 30011 を通じて出力バッファ 30012 より出力される。

[0362] 画素 30002 における一般的な動作は、最初に転送トランジスタ T_r1 のゲートとリセットトランジスタ T_r2 のゲートをオン状態にしてフォトダイオード 30021 の電荷を全て空にする。次いで、転送トランジスタ T_r1 のゲートとリセットトランジスタ T_r2 のゲートをオフ状態にして電荷蓄積

を行う。次に、フォトダイオード30021の電荷を読み出す直前にリセットトランジスタTr2のゲートをオン状態にしてFD領域30022の電位をリセットする。その後、リセットトランジスタTr2のゲートをオフ状態にし、転送トランジスタTr1のゲートをオン状態にしてフォトダイオード30021からの電荷をFD領域30022へ転送する。増幅トランジスタTr3ではゲートに電荷が印加されたことを受けて信号電荷を電氣的に増幅する。一方、選択トランジスタTr4は前記読み出し直前のFDリセット時から読み出し対象画素のみオン状態になり、該当画素内増幅トランジスタTr3からの電荷－電圧変換された画像信号が垂直信号線30008に読み出されることになる。

[0363] 以上、本開示に係る技術が適用され得る固体撮像装置の他の構造例について説明した。

[0364] (カメラへの適用例)

上述の固体撮像装置は、例えば、デジタルカメラやビデオカメラ等のカメラシステム、撮像機能を有する携帯電話、又は、撮像機能を備えた他の機器などの電子機器に適用することができる。以下、電子機器の一構成例として、カメラを例に挙げ説明する。図27Cは、本開示に係る技術が適用され得るビデオカメラの構成例を示す説明図である。

[0365] この例のカメラ10000は、固体撮像装置10001と、固体撮像装置10001の受光センサ部に入射光を導く光学系10002と、固体撮像装置10001及び光学系10002間に設けられたシャッタ装置10003と、固体撮像装置10001を駆動する駆動回路10004とを備える。さらに、カメラ10000は、固体撮像装置10001の出力信号を処理する信号処理回路10005を備える。

[0366] 光学系(光学レンズ)10002は、被写体からの像光(入射光)を固体撮像装置10001の撮像面(不図示)上に結像させる。これにより、固体撮像装置10001内に、一定期間、信号電荷が蓄積される。なお、光学系10002は、複数の光学レンズを含む光学レンズ群で構成してもよい。ま

た、シャッタ装置１０００３は、入射光の固体撮像装置１０００１への光照射期間及び遮光期間を制御する。

[0367] 駆動回路１０００４は、固体撮像装置１０００１及びシャッタ装置１０００３に駆動信号を供給する。そして、駆動回路１０００４は、供給した駆動信号により、固体撮像装置１０００１の信号処理回路１０００５への信号出力動作、及び、シャッタ装置１０００３のシャッタ動作を制御する。すなわち、この例では、駆動回路１０００４から供給される駆動信号（タイミング信号）により、固体撮像装置１０００１から信号処理回路１０００５への信号転送動作を行う。

[0368] 信号処理回路１０００５は、固体撮像装置１０００１から転送された信号に対して、各種の信号処理を施す。そして、各種信号処理が施された信号（ＡＶ－ＳＩＧＮＡＬ）は、メモリなどの記憶媒体（不図示）に記憶される、又は、モニタ（不図示）に出力される。

[0369] 以上、本開示に係る技術が適用され得るカメラの一例について説明した。

[0370] （内視鏡手術システムへの適用例）

例えば、本開示に係る技術は、内視鏡手術システムに適用されてもよい。

[0371] 図２７Ｄは、本開示に係る技術（本技術）が適用され得る内視鏡手術システムの概略的な構成の一例を示す図である。

[0372] 図２７Ｄでは、術者（医師）１１１３１が、内視鏡手術システム１１０００を用いて、患者ベッド１１１３３上の患者１１１３２に手術を行っている様子が図示されている。図示するように、内視鏡手術システム１１０００は、内視鏡１１１００と、気腹チューブ１１１１１やエネルギー処置具１１１１２等の、その他の術具１１１１０と、内視鏡１１１００を支持する支持アーム装置１１１２０と、内視鏡下手術のための各種の装置が搭載されたカート１１２００と、から構成される。

[0373] 内視鏡１１１００は、先端から所定の長さの領域が患者１１１３２の体腔内に挿入される鏡筒１１１０１と、鏡筒１１１０１の基端に接続されるカメラヘッド１１１０２と、から構成される。図示する例では、硬性の鏡筒１１

１０１を有するいわゆる硬性鏡として構成される内視鏡１１１００を図示しているが、内視鏡１１１００は、軟性の鏡筒を有するいわゆる軟性鏡として構成されてもよい。

[0374] 鏡筒１１１０１の先端には、対物レンズが嵌め込まれた開口部が設けられている。内視鏡１１１００には光源装置１１２０３が接続されており、当該光源装置１１２０３によって生成された光が、鏡筒１１１０１の内部に延設されるライトガイドによって当該鏡筒の先端まで導光され、対物レンズを介して患者１１１３２の体腔内の観察対象に向かって照射される。なお、内視鏡１１１００は、直視鏡であってもよいし、斜視鏡又は側視鏡であってもよい。

[0375] カメラヘッド１１１０２の内部には光学系及び撮像素子が設けられており、観察対象からの反射光（観察光）は当該光学系によって当該撮像素子に集光される。当該撮像素子によって観察光が光電変換され、観察光に対応する電気信号、すなわち観察像に対応する画像信号が生成される。当該画像信号は、RAWデータとしてカメラコントロールユニット（CCU: Camera Control Unit）１１２０１に送信される。

[0376] CCU１１２０１は、CPU（Central Processing Unit）やGPU（Graphics Processing Unit）等によって構成され、内視鏡１１１００及び表示装置１１２０２の動作を統括的に制御する。さらに、CCU１１２０１は、カメラヘッド１１１０２から画像信号を受け取り、その画像信号に対して、例えば現像処理（デモザイク処理）等の、当該画像信号に基づく画像を表示するための各種の画像処理を施す。

[0377] 表示装置１１２０２は、CCU１１２０１からの制御により、当該CCU１１２０１によって画像処理が施された画像信号に基づく画像を表示する。

[0378] 光源装置１１２０３は、例えばLED（light emitting diode）等の光源から構成され、術部等を撮影する際の照射光を内視鏡１１１００に供給する。

- [0379] 入力装置 11204 は、内視鏡手術システム 11000 に対する入力インタフェースである。ユーザは、入力装置 11204 を介して、内視鏡手術システム 11000 に対して各種の情報の入力や指示入力を行うことができる。例えば、ユーザは、内視鏡 11100 による撮像条件（照射光の種類、倍率及び焦点距離等）を変更する旨の指示等を入力する。
- [0380] 処置具制御装置 11205 は、組織の焼灼、切開又は血管の封止等のためのエネルギー処置具 11112 の駆動を制御する。気腹装置 11206 は、内視鏡 11100 による視野の確保及び術者の作業空間の確保の目的で、患者 11132 の体腔を膨らめるために、気腹チューブ 11111 を介して当該体腔内にガスを送り込む。レコーダ 11207 は、手術に関する各種の情報を記録可能な装置である。プリンタ 11208 は、手術に関する各種の情報を、テキスト、画像又はグラフ等各種の形式で印刷可能な装置である。
- [0381] なお、内視鏡 11100 に術部を撮影する際の照射光を供給する光源装置 11203 は、例えば LED、レーザ光源又はこれらの組み合わせによって構成される白色光源から構成することができる。RGB レーザ光源の組み合わせにより白色光源が構成される場合には、各色（各波長）の出力強度及び出力タイミングを高精度に制御することができるため、光源装置 11203 において撮像画像のホワイトバランスの調整を行うことができる。また、この場合には、RGB レーザ光源それぞれからのレーザ光を時分割で観察対象に照射し、その照射タイミングに同期してカメラヘッド 11102 の撮像素子の駆動を制御することにより、RGB それぞれに対応した画像を時分割で撮像することも可能である。当該方法によれば、当該撮像素子にカラーフィルタを設けなくても、カラー画像を得ることができる。
- [0382] また、光源装置 11203 は、出力する光の強度を所定の時間ごとに変更するようにその駆動が制御されてもよい。その光の強度の変更のタイミングに同期してカメラヘッド 11102 の撮像素子の駆動を制御して時分割で画像を取得し、その画像を合成することにより、いわゆる黒つぶれ及び白とびのない高ダイナミックレンジの画像を生成することができる。

[0383] また、光源装置 11203 は、特殊光観察に対応した所定の波長帯域の光を供給可能に構成されてもよい。特殊光観察では、例えば、体組織における光の吸収の波長依存性を利用して、通常の観察時における照射光（すなわち、白色光）に比べて狭帯域の光を照射することにより、粘膜表層の血管等の所定の組織を高コントラストで撮影する、いわゆる狭帯域光観察（Narrow Band Imaging）が行われる。あるいは、特殊光観察では、励起光を照射することにより発生する蛍光により画像を得る蛍光観察が行われてもよい。蛍光観察では、体組織に励起光を照射し当該体組織からの蛍光を観察すること（自家蛍光観察）、又はインドシアニンググリーン（ICG）等の試薬を体組織に局注するとともに当該体組織にその試薬の蛍光波長に対応した励起光を照射し蛍光像を得ること等を行うことができる。光源装置 11203 は、このような特殊光観察に対応した狭帯域光及び／又は励起光を供給可能に構成され得る。

[0384] 図 27E は、図 27D に示すカメラヘッド 11102 及び CCU 11201 の機能構成の一例を示すブロック図である。

[0385] カメラヘッド 11102 は、レンズユニット 11401 と、撮像部 11402 と、駆動部 11403 と、通信部 11404 と、カメラヘッド制御部 11405 と、を有する。CCU 11201 は、通信部 11411 と、画像処理部 11412 と、制御部 11413 と、を有する。カメラヘッド 11102 と CCU 11201 とは、伝送ケーブル 11400 によって互いに通信可能に接続されている。

[0386] レンズユニット 11401 は、鏡筒 11101 との接続部に設けられる光学系である。鏡筒 11101 の先端から取り込まれた観察光は、カメラヘッド 11102 まで導光され、当該レンズユニット 11401 に入射する。レンズユニット 11401 は、ズームレンズ及びフォーカスレンズを含む複数のレンズが組み合わされて構成される。

[0387] 撮像部 11402 を構成する撮像素子は、1つ（いわゆる単板式）であってもよいし、複数（いわゆる多板式）であってもよい。撮像部 11402 が

多板式で構成される場合には、例えば各撮像素子によってRGBそれぞれに対応する画像信号が生成され、それらが合成されることによりカラー画像が得られてもよい。あるいは、撮像部11402は、3D (dimensional) 表示に対応する右目用及び左目用の画像信号をそれぞれ取得するための1対の撮像素子を有するように構成されてもよい。3D表示が行われることにより、術者11131は術部における生体組織の奥行きをより正確に把握することが可能になる。なお、撮像部11402が多板式で構成される場合には、各撮像素子に対応して、レンズユニット11401も複数系統設けられ得る。

[0388] また、撮像部11402は、必ずしもカメラヘッド11102に設けられなくてもよい。例えば、撮像部11402は、鏡筒11101の内部に、対物レンズの直後に設けられてもよい。

[0389] 駆動部11403は、アクチュエータによって構成され、カメラヘッド制御部11405からの制御により、レンズユニット11401のズームレンズ及びフォーカスレンズを光軸に沿って所定の距離だけ移動させる。これにより、撮像部11402による撮像画像の倍率及び焦点が適宜調整され得る。

[0390] 通信部11404は、CCU11201との間で各種の情報を送受信するための通信装置によって構成される。通信部11404は、撮像部11402から得た画像信号をRAWデータとして伝送ケーブル11400を介してCCU11201に送信する。

[0391] また、通信部11404は、CCU11201から、カメラヘッド11102の駆動を制御するための制御信号を受信し、カメラヘッド制御部11405に供給する。当該制御信号には、例えば、撮像画像のフレームレートを指定する旨の情報、撮像時の露出値を指定する旨の情報、並びに／又は撮像画像の倍率及び焦点を指定する旨の情報等、撮像条件に関する情報が含まれる。

[0392] なお、上記のフレームレートや露出値、倍率、焦点等の撮像条件は、ユーザによって適宜指定されてもよいし、取得された画像信号に基づいてCCU

１１２０１の制御部１１４１３によって自動的に設定されてもよい。後者の場合には、いわゆるＡＥ（Auto Exposure）機能、ＡＦ（Auto Focus）機能及びＡＷＢ（Auto White Balance）機能が内視鏡１１１００に搭載されていることになる。

[0393] カメラヘッド制御部１１４０５は、通信部１１４０４を介して受信したＣＣＵ１１２０１からの制御信号に基づいて、カメラヘッド１１１０２の駆動を制御する。

[0394] 通信部１１４１１は、カメラヘッド１１１０２との間で各種の情報を送受信するための通信装置によって構成される。通信部１１４１１は、カメラヘッド１１１０２から、伝送ケーブル１１４００を介して送信される画像信号を受信する。

[0395] また、通信部１１４１１は、カメラヘッド１１１０２に対して、カメラヘッド１１１０２の駆動を制御するための制御信号を送信する。画像信号や制御信号は、電気通信や光通信等によって送信することができる。

[0396] 画像処理部１１４１２は、カメラヘッド１１１０２から送信されたＲＡＷデータである画像信号に対して各種の画像処理を施す。

[0397] 制御部１１４１３は、内視鏡１１１００による術部等の撮像、及び、術部等の撮像により得られる撮像画像の表示に関する各種の制御を行う。例えば、制御部１１４１３は、カメラヘッド１１１０２の駆動を制御するための制御信号を生成する。

[0398] また、制御部１１４１３は、画像処理部１１４１２によって画像処理が施された画像信号に基づいて、術部等が映った撮像画像を表示装置１１２０２に表示させる。この際、制御部１１４１３は、各種の画像認識技術を用いて撮像画像内における各種の物体を認識してもよい。例えば、制御部１１４１３は、撮像画像に含まれる物体のエッジの形状や色等を検出することにより、鉗子等の術具、特定の生体部位、出血、エネルギー処置具１１１１２の使用時のミスト等を認識することができる。制御部１１４１３は、表示装置１１２０２に撮像画像を表示させる際に、その認識結果を用いて、各種の手術

支援情報を当該術部の画像に重畳表示させてもよい。手術支援情報が重畳表示され、術者１１１３１に提示されることにより、術者１１１３１の負担を軽減することや、術者１１１３１が確実に手術を進めることが可能になる。

[0399] カメラヘッド１１１０２及びＣＣＵ１１２０１を接続する伝送ケーブル１１４００は、電気信号の通信に対応した電気信号ケーブル、光通信に対応した光ファイバ、又はこれらの複合ケーブルである。

[0400] ここで、図示する例では、伝送ケーブル１１４００を用いて有線で通信が行われていたが、カメラヘッド１１１０２とＣＣＵ１１２０１との間の通信は無線で行われてもよい。

[0401] 以上、本開示に係る技術が適用され得る内視鏡手術システムの一例について説明した。本開示に係る技術は、以上説明した構成のうち、例えば、カメラヘッド１１１０２の撮像部１１４０２に適用され得る。撮像部１１４０２に本開示に係る技術を適用することにより、より鮮明な術部画像を得ることができるため、術者が術部を確実に確認することが可能になる。

[0402] なお、ここでは、一例として内視鏡手術システムについて説明したが、本開示に係る技術は、その他、例えば、顕微鏡手術システム等に適用されてもよい。

[0403] （移動体への適用例）

例えば、本開示に係る技術は、自動車、電気自動車、ハイブリッド電気自動車、自動二輪車、自転車、パーソナルモビリティ、飛行機、ドローン、船舶、ロボット等のいずれかの種類の移動体に搭載される装置として実現されてもよい。

[0404] 図２７Ｆは、本開示に係る技術が適用され得る移動体制御システムの一例である車両制御システムの概略的な構成例を示すブロック図である。

[0405] 車両制御システム１２０００は、通信ネットワーク１２００１を介して接続された複数の電子制御ユニットを備える。図２７Ｆに示した例では、車両制御システム１２０００は、駆動系制御ユニット１２０１０、ボディ系制御ユニット１２０２０、車外情報検出ユニット１２０３０、車内情報検出ユニ

ット１２０４０、及び統合制御ユニット１２０５０を備える。また、統合制御ユニット１２０５０の機能構成として、マイクロコンピュータ１２０５１、音声画像出力部１２０５２、及び車載ネットワークＩ／Ｆ（Interface）１２０５３が図示されている。

[0406] 駆動系制御ユニット１２０１０は、各種プログラムにしたがって車両の駆動系に関連する装置の動作を制御する。例えば、駆動系制御ユニット１２０１０は、内燃機関又は駆動用モータ等の車両の駆動力を発生させるための駆動力発生装置、駆動力を車輪に伝達するための駆動力伝達機構、車両の舵角を調節するステアリング機構、及び、車両の制動力を発生させる制動装置等の制御装置として機能する。

[0407] ボディ系制御ユニット１２０２０は、各種プログラムにしたがって車体に装備された各種装置の動作を制御する。例えば、ボディ系制御ユニット１２０２０は、キーレスエントリシステム、スマートキーシステム、パワーウィンドウ装置、あるいは、ヘッドランプ、バックランプ、ブレーキランプ、ウinker又はフォグランプ等の各種ランプの制御装置として機能する。この場合、ボディ系制御ユニット１２０２０には、鍵を代替する携帯機から発信される電波又は各種スイッチの信号が入力され得る。ボディ系制御ユニット１２０２０は、これらの電波又は信号の入力を受け付け、車両のドアロック装置、パワーウィンドウ装置、ランプ等を制御する。

[0408] 車外情報検出ユニット１２０３０は、車両制御システム１２０００を搭載した車両の外部の情報を検出する。例えば、車外情報検出ユニット１２０３０には、撮像部１２０３１が接続される。車外情報検出ユニット１２０３０は、撮像部１２０３１に車外の画像を撮像させるとともに、撮像された画像を受信する。車外情報検出ユニット１２０３０は、受信した画像に基づいて、人、車、障害物、標識又は路面上の文字等の物体検出処理又は距離検出処理を行ってもよい。

[0409] 撮像部１２０３１は、光を受光し、その光の受光量に応じた電気信号を出力する光センサである。撮像部１２０３１は、電気信号を画像として出力す

ることもできるし、測距の情報として出力することもできる。また、撮像部 12031 が受光する光は、可視光であっても良いし、赤外線等の非可視光であっても良い。

[0410] 車内情報検出ユニット 12040 は、車内の情報を検出する。車内情報検出ユニット 12040 には、例えば、運転者の状態を検出する運転者状態検出部 12041 が接続される。運転者状態検出部 12041 は、例えば運転者を撮像するカメラを含み、車内情報検出ユニット 12040 は、運転者状態検出部 12041 から入力される検出情報に基づいて、運転者の疲労度合い又は集中度合いを算出してもよいし、運転者が居眠りをしていないかを判別してもよい。

[0411] マイクロコンピュータ 12051 は、車外情報検出ユニット 12030 又は車内情報検出ユニット 12040 で取得される車内外の情報に基づいて、駆動力発生装置、ステアリング機構又は制動装置の制御目標値を演算し、駆動系制御ユニット 12010 に対して制御指令を出力することができる。例えば、マイクロコンピュータ 12051 は、車両の衝突回避あるいは衝撃緩和、車間距離に基づく追従走行、車速維持走行、車両の衝突警告、又は車両のレーン逸脱警告等を含む A D A S (Advanced Driver Assistance System) の機能実現を目的とした協調制御を行うことができる。

[0412] また、マイクロコンピュータ 12051 は、車外情報検出ユニット 12030 又は車内情報検出ユニット 12040 で取得される車両の周囲の情報に基づいて駆動力発生装置、ステアリング機構又は制動装置等を制御することにより、運転者の操作に拠らずに自律的に走行する自動運転等を目的とした協調制御を行うことができる。

[0413] また、マイクロコンピュータ 12051 は、車外情報検出ユニット 12030 で取得される車外の情報に基づいて、ボディ系制御ユニット 12020 に対して制御指令を出力することができる。例えば、マイクロコンピュータ 12051 は、車外情報検出ユニット 12030 で検知した先行車又は対向車の位置に応じてヘッドランプを制御し、ハイビームをロービームに切り替

える等の防眩を図ることを目的とした協調制御を行うことができる。

[0414] 音声画像出力部 12052 は、車両の搭乗者又は車外に対して、視覚的又は聴覚的に情報を通知することが可能な出力装置へ音声及び画像のうちの少なくとも一方の出力信号を送信する。図 27F の例では、出力装置として、オーディオスピーカ 12061、表示部 12062 及びインストルメントパネル 12063 が例示されている。表示部 12062 は、例えば、オンボードディスプレイ及びヘッドアップディスプレイの少なくとも一つを含んでもよい。

[0415] 図 27G は、撮像部 12031 の設置位置の例を示す図である。

[0416] 図 27G では、撮像部 12031 として、撮像部 12101、12102、12103、12104、12105 を有する。

[0417] 撮像部 12101、12102、12103、12104、12105 は、例えば、車両 12100 のフロントノーズ、サイドミラー、リアバンパ、バックドア及び車室内のフロントガラスの上部等の位置に設けられる。フロントノーズに備えられる撮像部 12101 及び車室内のフロントガラスの上部に備えられる撮像部 12105 は、主として車両 12100 の前方の画像を取得する。サイドミラーに備えられる撮像部 12102、12103 は、主として車両 12100 の側方の画像を取得する。リアバンパ又はバックドアに備えられる撮像部 12104 は、主として車両 12100 の後方の画像を取得する。車室内のフロントガラスの上部に備えられる撮像部 12105 は、主として先行車両又は、歩行者、障害物、信号機、交通標識又は車線等の検出に用いられる。

[0418] なお、図 1022 には、撮像部 12101 ないし 12104 の撮影範囲の一例が示されている。撮像範囲 12111 は、フロントノーズに設けられた撮像部 12101 の撮像範囲を示し、撮像範囲 12112、12113 は、それぞれサイドミラーに設けられた撮像部 12102、12103 の撮像範囲を示し、撮像範囲 12114 は、リアバンパ又はバックドアに設けられた撮像部 12104 の撮像範囲を示す。例えば、撮像部 12101 ないし 12

104で撮像された画像データが重ね合わせられることにより、車両12100を上方から見た俯瞰画像が得られる。

[0419] 撮像部12101ないし12104の少なくとも1つは、距離情報を取得する機能を有していてもよい。例えば、撮像部12101ないし12104の少なくとも1つは、複数の撮像素子からなるステレオカメラであってもよい、位相差検出用の画素を有する撮像素子であってもよい。

[0420] 例えば、マイクロコンピュータ12051は、撮像部12101ないし12104から得られた距離情報を基に、撮像範囲12111ないし12114内における各立体物までの距離と、この距離の時間的変化（車両12100に対する相対速度）を求めることにより、特に車両12100の進行路上にある最も近い立体物で、車両12100と略同じ方向に所定の速度（例えば、0km/h以上）で走行する立体物を先行車として抽出することができる。さらに、マイクロコンピュータ12051は、先行車の手前に予め確保すべき車間距離を設定し、自動ブレーキ制御（追従停止制御も含む）や自動加速制御（追従発進制御も含む）等を行うことができる。このように運転者の操作に拠らずに自律的に走行する自動運転等を目的とした協調制御を行うことができる。

[0421] 例えば、マイクロコンピュータ12051は、撮像部12101ないし12104から得られた距離情報を元に、立体物に関する立体物データを、2輪車、普通車両、大型車両、歩行者、電柱等その他の立体物に分類して抽出し、障害物の自動回避に用いることができる。例えば、マイクロコンピュータ12051は、車両12100の周辺の障害物を、車両12100のドライバが視認可能な障害物と視認困難な障害物とに識別する。そして、マイクロコンピュータ12051は、各障害物との衝突の危険度を示す衝突リスクを判断し、衝突リスクが設定値以上で衝突可能性がある状況であるときには、オーディオスピーカ12061や表示部12062を介してドライバに警報を出力することや、駆動系制御ユニット12010を介して強制減速や回避操舵を行うことで、衝突回避のための運転支援を行うことができる。

[0422] 撮像部 12101 ないし 12104 の少なくとも 1 つは、赤外線を検出する赤外線カメラであってもよい。例えば、マイクロコンピュータ 12051 は、撮像部 12101 ないし 12104 の撮像画像中に歩行者が存在するかどうかを判定することで歩行者を認識することができる。かかる歩行者の認識は、例えば赤外線カメラとしての撮像部 12101 ないし 12104 の撮像画像における特徴点を抽出する手順と、物体の輪郭を示す一連の特徴点にパターンマッチング処理を行って歩行者か否かを判別する手順によって行われる。マイクロコンピュータ 12051 が、撮像部 12101 ないし 12104 の撮像画像中に歩行者が存在すると判定し、歩行者を認識すると、音声画像出力部 12052 は、当該認識された歩行者に強調のための方形輪郭線を重畳表示するように、表示部 12062 を制御する。また、音声画像出力部 12052 は、歩行者を示すアイコン等を所望の位置に表示するように表示部 12062 を制御してもよい。

[0423] 以上、本開示に係る技術が適用され得る車両制御システムの一例について説明した。本開示に係る技術は、以上説明した構成のうち、撮像部 12031 等に適用され得る。撮像部 12031 に本開示に係る技術を適用することにより、より見やすい撮影画像を得ることができるため、ドライバの疲労を軽減することが可能になる。また、より認識しやすい撮影画像を得ることができるため、運転支援の精度を向上させることができる。

[0424] (6. 補足)

以上、添付図面を参照しながら本開示の好適な実施形態について詳細に説明したが、本開示の技術的範囲はかかる例に限定されない。本開示の技術分野における通常の知識を有する者であれば、特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本開示の技術的範囲に属するものと了解される。また、添付図面は、本開示の一実施形態を模式的に示すものであるため、添付図面に示す各構成の大きさの割合は、実際の各構成の大きさの割合と異なる場合があり得る。

[0425] なお、本実施形態に係る固体撮像装置 1 ～ 2 5 E では、上述した第 1 の接続構造、第 2 の接続構造、及び第 3 の接続構造以外に、必要に応じて、各基板の間を電氣的に接続する接続構造を備えていてもよいことは言うまでもない。例えば、上述した画素 A D C を実行するために、固体撮像装置 1 は、画素又は画素群ごとに、第 1 基板 1 1 0 A 及び第 2 基板 1 1 0 B の信号線及び電源線の各々を電氣的に接続する電極接合構造 1 5 9 が設けられていてもよい。また、固体撮像装置 1 ～ 2 5 E が備える各種配線は、本実施形態に係る固体撮像装置 1 ～ 2 5 E の機能を実現するために、図示しない断面において、互いに接続されていることがあり得ることは言うまでもない。

[0426] また、本明細書に記載された効果は、あくまで説明的または例示的なものであって限定的ではない。つまり、本開示に係る技術は、上記の効果とともに、または上記の効果に代えて、本明細書の記載から当業者には明らかな他の効果を奏しうる。

[0427] なお、以下のような構成も本開示の技術的範囲に属する。

(1)

画素が配列された画素部が形成された第 1 半導体基板と、前記第 1 半導体基板上に積層された第 1 多層配線層と、を有する第 1 基板と、

所定の機能を有する回路が形成された第 2 半導体基板と、前記第 2 半導体基板上に積層された第 2 多層配線層と、を有する第 2 基板と、

所定の機能を有する回路が形成された第 3 半導体基板と、前記第 3 半導体基板上に積層された第 3 多層配線層と、を有する第 3 基板と、

がこの順に積層されて構成され、

前記第 1 基板と前記第 2 基板とは、前記第 1 多層配線層と前記第 2 半導体基板とが対向するように貼り合わされ、

前記第 1 基板の回路と前記第 2 基板の回路とを電氣的に接続するための第 1 の接続構造を有し、

前記第 1 の接続構造は、前記第 1 多層配線層内の所定の配線を露出させる第 1 の貫通孔と、前記第 2 多層配線層内の所定の配線を露出させる前記第 1

の貫通孔とは異なる第２の貫通孔と、に導電材料が埋め込まれた構造、又は前記第１の貫通孔及び前記第２の貫通孔の内壁に導電材料が成膜された構造、を有するビア、を含む、

固体撮像装置。

(２)

前記第２基板の回路と前記第３基板の回路とを電氣的に接続するための第２の接続構造を更に有し、

前記第２の接続構造は、前記第２多層配線層内の所定の配線を露出させるように前記第１基板の裏面側から少なくとも前記第１基板を貫通して設けられる開口部、及び前記第３多層配線層内の所定の配線を露出させるように前記第１基板の裏面側から少なくとも前記第１基板及び前記第２基板を貫通して設けられる開口部、を含む、

前記（１）に記載の固体撮像装置。

(３)

前記開口部によって露出させられる前記第２多層配線層内の前記所定の配線及び前記第３多層配線層内の前記所定の配線は、Ｉ／Ｏ部として機能するパッドである、

前記（２）に記載の固体撮像装置。

(４)

前記第１基板の裏面上にＩ／Ｏ部として機能するパッドが存在し、

前記開口部の内壁には導電材料が成膜されており、

前記導電材料によって、前記開口部によって露出させられる前記第２多層配線層内の前記所定の配線及び前記第３多層配線層内の前記所定の配線が、前記パッドと電氣的に接続されている、

前記（２）に記載の固体撮像装置。

(５)

前記第２多層配線層内の前記所定の配線及び前記第３多層配線層内の前記所定の配線が、前記導電材料によって、同一の前記パッドと電氣的に接続さ

れる、

前記（４）に記載の固体撮像装置。

（６）

前記第２多層配線層内の前記所定の配線及び前記第３多層配線層内の前記所定の配線が、前記導電材料によって、それぞれ異なる前記パッドと電氣的に接続される、

前記（４）に記載の固体撮像装置。

（７）

前記第２基板の回路と前記第３基板の回路とを電氣的に接続するための第２の接続構造を更に有し、

前記第２基板と前記第３基板とは、前記第２多層配線層と前記第３多層配線層とが対向するように貼り合わされ、

前記第２の接続構造は、前記第２基板又は前記第３基板を貫通して設けられ、前記第２多層配線層内の所定の配線と、前記第３多層配線層内の所定の配線と、を電氣的に接続するビア、を含む、

前記（１）に記載の固体撮像装置。

（８）

前記ビアは、前記第２多層配線層内の前記所定の配線を露出させる第１の貫通孔と、前記第３多層配線層内の前記所定の配線を露出させる前記第１の貫通孔とは異なる第２の貫通孔と、に導電材料が埋め込まれた構造、又は前記第１の貫通孔及び前記第２の貫通孔の内壁に導電材料が成膜された構造、を有する、

前記（７）に記載の固体撮像装置。

（９）

前記ビアは、前記第２多層配線層内の前記所定の配線と接触して前記第３多層配線層内の前記所定の配線を露出させるように設けられる１つの貫通孔、若しくは前記第３多層配線層内の前記所定の配線と接触して前記第２多層配線層内の前記所定の配線を露出させるように設けられる１つの貫通孔、に

導電材料が埋め込まれた構造、又は前記第 1 の貫通孔及び前記第 2 の貫通孔の内壁に導電材料が成膜された構造、を有する、

前記（7）に記載の固体撮像装置。

（10）

前記第 1 基板の回路と前記第 3 基板の回路とを電氣的に接続するための第 3 の接続構造を更に有し、

前記第 2 基板と前記第 3 基板とは、前記第 2 多層配線層と前記第 3 多層配線層とが対向するように貼り合わされ、

前記第 3 の接続構造は、前記第 1 基板の裏面側又は前記第 3 基板の裏面側から少なくとも前記第 2 基板を貫通して設けられ、前記第 1 多層配線層内の所定の配線と、前記第 3 多層配線層内の所定の配線と、を電氣的に接続するビア、を含む、

前記（1）に記載の固体撮像装置。

（11）

前記ビアは、前記第 1 多層配線層内の前記所定の配線を露出させる第 1 の貫通孔と、前記第 3 多層配線層内の前記所定の配線を露出させる前記第 1 の貫通孔とは異なる第 2 の貫通孔と、に導電材料が埋め込まれた構造、又は前記第 1 の貫通孔及び前記第 2 の貫通孔の内壁に導電材料が成膜された構造、を有する、

前記（10）に記載の固体撮像装置。

（12）

前記ビアは、前記第 3 多層配線層内の前記所定の配線と接触して前記第 1 多層配線層内の前記所定の配線を露出させるように設けられる 1 つの貫通孔に、導電材料が埋め込まれた構造、又は前記貫通孔の内壁に導電材料が成膜された構造、を有する、

前記（10）に記載の固体撮像装置。

（13）

前記ビアは、前記第 2 多層配線層内の所定の配線とも電氣的に接続されて

いる、

前記（１２）に記載の固体撮像装置。

（１４）

前記第２基板の回路と前記第３基板の回路とを電氣的に接続するための第２の接続構造を更に有し、

前記第２の接続構造は、前記第２基板及び前記第３基板の貼り合わせ面に存在し、前記貼り合わせ面にそれぞれ形成される電極同士が直接接触した状態で接合している電極接合構造、を含む、

前記（１）～（１３）のいずれか一項に記載の固体撮像装置。

（１５）

前記第２基板及び前記第３基板は、前記固体撮像装置の動作に係る各種の信号処理を実行するロジック回路、及び前記第１基板の前記画素の各々によって取得された画素信号を一時的に保持するメモリ回路、の少なくともいずれかを有する、

前記（１）～（１４）のいずれか一項に記載の固体撮像装置。

（１６）

前記第２基板は、前記第１基板の前記画素の各々によって取得された画素信号をＡＤ変換する画素信号処理回路を有し、

前記第１の接続構造は、前記画素信号を前記画素信号処理回路に伝送するために、前記画素の各々に対応して存在する、

前記（１）～（１５）のいずれか一項に記載の固体撮像装置。

（１７）

観察対象を電子的に撮影する固体撮像装置、を備え、

前記固体撮像装置は、

画素が配列された画素部が形成された第１半導体基板と、前記第１半導体基板上に積層された第１多層配線層と、を有する第１基板と、

所定の機能を有する回路が形成された第２半導体基板と、前記第２半導体基板上に積層された第２多層配線層と、を有する第２基板と、

所定の機能を有する回路が形成された第3半導体基板と、前記第3半導体基板上に積層された第3多層配線層と、を有する第3基板と、

がこの順に積層されて構成され、

前記第1基板と前記第2基板とは、前記第1多層配線層と前記第2半導体基板とが対向するように貼り合わされ、

前記第1基板の回路と前記第2基板の回路とを電氣的に接続するための第1の接続構造を有し、

前記第1の接続構造は、前記第1多層配線層内の所定の配線を露出させる第1の貫通孔と、前記第2多層配線層内の所定の配線を露出させる前記第1の貫通孔とは異なる第2の貫通孔と、に導電材料が埋め込まれた構造、又は前記第1の貫通孔及び前記第2の貫通孔の内壁に導電材料が成膜された構造、を有するビア、を含む、

電子機器。

符号の説明

- [0428] 1、1a、1b、6A～6G、7A～7P、8A～8J、9A～9H、10A～10J、11A～11H、12A～12P、13A～13J、14A～14P、15A～15J、16A～16C、17A～17F、18A～18E、19A～19F、20A～20E、21A～21C、22A～22F、23A～23E、24A～24F、25A～25E 固体撮像装置
- 101、121、131 半導体基板
- 103、109、123、129、133 絶縁膜
- 105、125、135 多層配線層
- 110A 第1基板
- 110B 第2基板
- 110C 第3基板
- 111 CF層
- 113 MLアレイ
- 151 パッド

153、153a、153b	パッド開口部	
155、155a、155b、155c、155d	引き出し線開口部	
157、157a、157b	TSV	
159、159a、159b	電極接合構造	
510	導電材料層	
901	スマートフォン（電子機器）	
911	デジタルカメラ（電子機器）	

請求の範囲

- [請求項1] 画素が配列された画素部が形成された第1半導体基板と、前記第1半導体基板上に積層された第1多層配線層と、を有する第1基板と、
所定の機能を有する回路が形成された第2半導体基板と、前記第2半導体基板上に積層された第2多層配線層と、を有する第2基板と、
所定の機能を有する回路が形成された第3半導体基板と、前記第3半導体基板上に積層された第3多層配線層と、を有する第3基板と、
がこの順に積層されて構成され、
前記第1基板と前記第2基板とは、前記第1多層配線層と前記第2半導体基板とが対向するように貼り合わされ、
前記第1基板の回路と前記第2基板の回路とを電氣的に接続するための第1の接続構造を有し、
前記第1の接続構造は、前記第1多層配線層内の所定の配線を露出させる第1の貫通孔と、前記第2多層配線層内の所定の配線を露出させる前記第1の貫通孔とは異なる第2の貫通孔と、に導電材料が埋め込まれた構造、又は前記第1の貫通孔及び前記第2の貫通孔の内壁に導電材料が成膜された構造、を有するビア、を含む、
固体撮像装置。
- [請求項2] 前記第2基板の回路と前記第3基板の回路とを電氣的に接続するための第2の接続構造を更に有し、
前記第2の接続構造は、前記第2多層配線層内の所定の配線を露出させるように前記第1基板の裏面側から少なくとも前記第1基板を貫通して設けられる開口部、及び前記第3多層配線層内の所定の配線を露出させるように前記第1基板の裏面側から少なくとも前記第1基板及び前記第2基板を貫通して設けられる開口部、を含む、
請求項1に記載の固体撮像装置。
- [請求項3] 前記開口部によって露出させられる前記第2多層配線層内の前記所定の配線及び前記第3多層配線層内の前記所定の配線は、 I/O 部と

して機能するパッドである、

請求項 2 に記載の固体撮像装置。

[請求項4]

前記第 1 基板の裏面上に I / O 部として機能するパッドが存在し、

前記開口部の内壁には導電材料が成膜されており、

前記導電材料によって、前記開口部によって露出させられる前記第 2 多層配線層内の前記所定の配線及び前記第 3 多層配線層内の前記所定の配線が、前記パッドと電氣的に接続されている、

請求項 2 に記載の固体撮像装置。

[請求項5]

前記第 2 多層配線層内の前記所定の配線及び前記第 3 多層配線層内の前記所定の配線が、前記導電材料によって、同一の前記パッドと電氣的に接続される、

請求項 4 に記載の固体撮像装置。

[請求項6]

前記第 2 多層配線層内の前記所定の配線及び前記第 3 多層配線層内の前記所定の配線が、前記導電材料によって、それぞれ異なる前記パッドと電氣的に接続される、

請求項 4 に記載の固体撮像装置。

[請求項7]

前記第 2 基板の回路と前記第 3 基板の回路とを電氣的に接続するための第 2 の接続構造を更に有し、

前記第 2 基板と前記第 3 基板とは、前記第 2 多層配線層と前記第 3 多層配線層とが対向するように貼り合わされ、

前記第 2 の接続構造は、前記第 2 基板又は前記第 3 基板を貫通して設けられ、前記第 2 多層配線層内の所定の配線と、前記第 3 多層配線層内の所定の配線と、を電氣的に接続するビア、を含む、

請求項 1 に記載の固体撮像装置。

[請求項8]

前記ビアは、前記第 2 多層配線層内の前記所定の配線を露出させる第 1 の貫通孔と、前記第 3 多層配線層内の前記所定の配線を露出させる前記第 1 の貫通孔とは異なる第 2 の貫通孔と、に導電材料が埋め込まれた構造、又は前記第 1 の貫通孔及び前記第 2 の貫通孔の内壁に導

電材料が成膜された構造、を有する、

請求項 7 に記載の固体撮像装置。

[請求項9] 前記ビアは、前記第 2 多層配線層内の前記所定の配線と接触して前記第 3 多層配線層内の前記所定の配線を露出させるように設けられる 1 つの貫通孔、若しくは前記第 3 多層配線層内の前記所定の配線と接触して前記第 2 多層配線層内の前記所定の配線を露出させるように設けられる 1 つの貫通孔、に導電材料が埋め込まれた構造、又は前記第 1 の貫通孔及び前記第 2 の貫通孔の内壁に導電材料が成膜された構造、を有する、

請求項 7 に記載の固体撮像装置。

[請求項10] 前記第 1 基板の回路と前記第 3 基板の回路とを電氣的に接続するための第 3 の接続構造を更に有し、

前記第 2 基板と前記第 3 基板とは、前記第 2 多層配線層と前記第 3 多層配線層とが対向するように貼り合わされ、

前記第 3 の接続構造は、前記第 1 基板の裏面側又は前記第 3 基板の裏面側から少なくとも前記第 2 基板を貫通して設けられ、前記第 1 多層配線層内の所定の配線と、前記第 3 多層配線層内の所定の配線と、を電氣的に接続するビア、を含む、

請求項 1 に記載の固体撮像装置。

[請求項11] 前記ビアは、前記第 1 多層配線層内の前記所定の配線を露出させる第 1 の貫通孔と、前記第 3 多層配線層内の前記所定の配線を露出させる前記第 1 の貫通孔とは異なる第 2 の貫通孔と、に導電材料が埋め込まれた構造、又は前記第 1 の貫通孔及び前記第 2 の貫通孔の内壁に導電材料が成膜された構造、を有する、

請求項 10 に記載の固体撮像装置。

[請求項12] 前記ビアは、前記第 3 多層配線層内の前記所定の配線と接触して前記第 1 多層配線層内の前記所定の配線を露出させるように設けられる 1 つの貫通孔に、導電材料が埋め込まれた構造、又は前記貫通孔の内

壁に導電材料が成膜された構造、を有する、

請求項 10 に記載の固体撮像装置。

[請求項13] 前記ビアは、前記第2多層配線層内の所定の配線とも電氣的に接続されている、

請求項 12 に記載の固体撮像装置。

[請求項14] 前記第2基板の回路と前記第3基板の回路とを電氣的に接続するための第2の接続構造を更に有し、

前記第2の接続構造は、前記第2基板及び前記第3基板の貼り合わせ面に存在し、前記貼り合わせ面にそれぞれ形成される電極同士が直接接触した状態で接合している電極接合構造、を含む、

請求項 1 に記載の固体撮像装置。

[請求項15] 前記第2基板及び前記第3基板は、前記固体撮像装置の動作に係る各種の信号処理を実行するロジック回路、及び前記第1基板の前記画素の各々によって取得された画素信号を一時的に保持するメモリ回路、の少なくともいずれかを有する、

請求項 1 に記載の固体撮像装置。

[請求項16] 前記第2基板は、前記第1基板の前記画素の各々によって取得された画素信号をAD変換する画素信号処理回路を有し、

前記第1の接続構造は、前記画素信号を前記画素信号処理回路に伝送するために、前記画素の各々に対応して存在する、

請求項 1 に記載の固体撮像装置。

[請求項17] 観察対象を電子的に撮影する固体撮像装置、を備え、

前記固体撮像装置は、

画素が配列された画素部が形成された第1半導体基板と、前記第1半導体基板上に積層された第1多層配線層と、を有する第1基板と、

所定の機能を有する回路が形成された第2半導体基板と、前記第2半導体基板上に積層された第2多層配線層と、を有する第2基板と、

所定の機能を有する回路が形成された第3半導体基板と、前記第3

半導体基板上に積層された第3多層配線層と、を有する第3基板と、
がこの順に積層されて構成され、

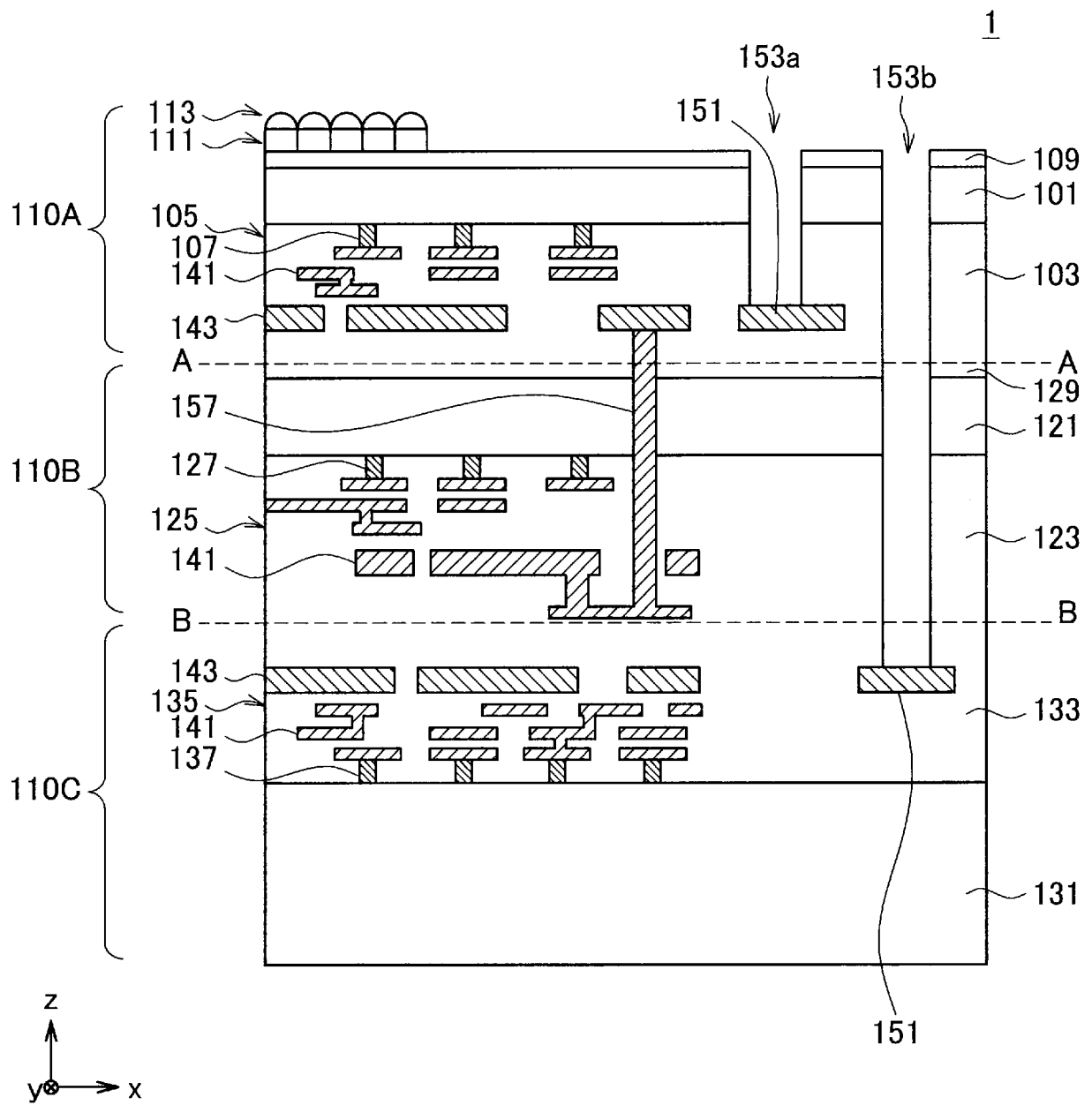
前記第1基板と前記第2基板とは、前記第1多層配線層と前記第2
半導体基板とが対向するように貼り合わされ、

前記第1基板の回路と前記第2基板の回路とを電氣的に接続するた
めの第1の接続構造を有し、

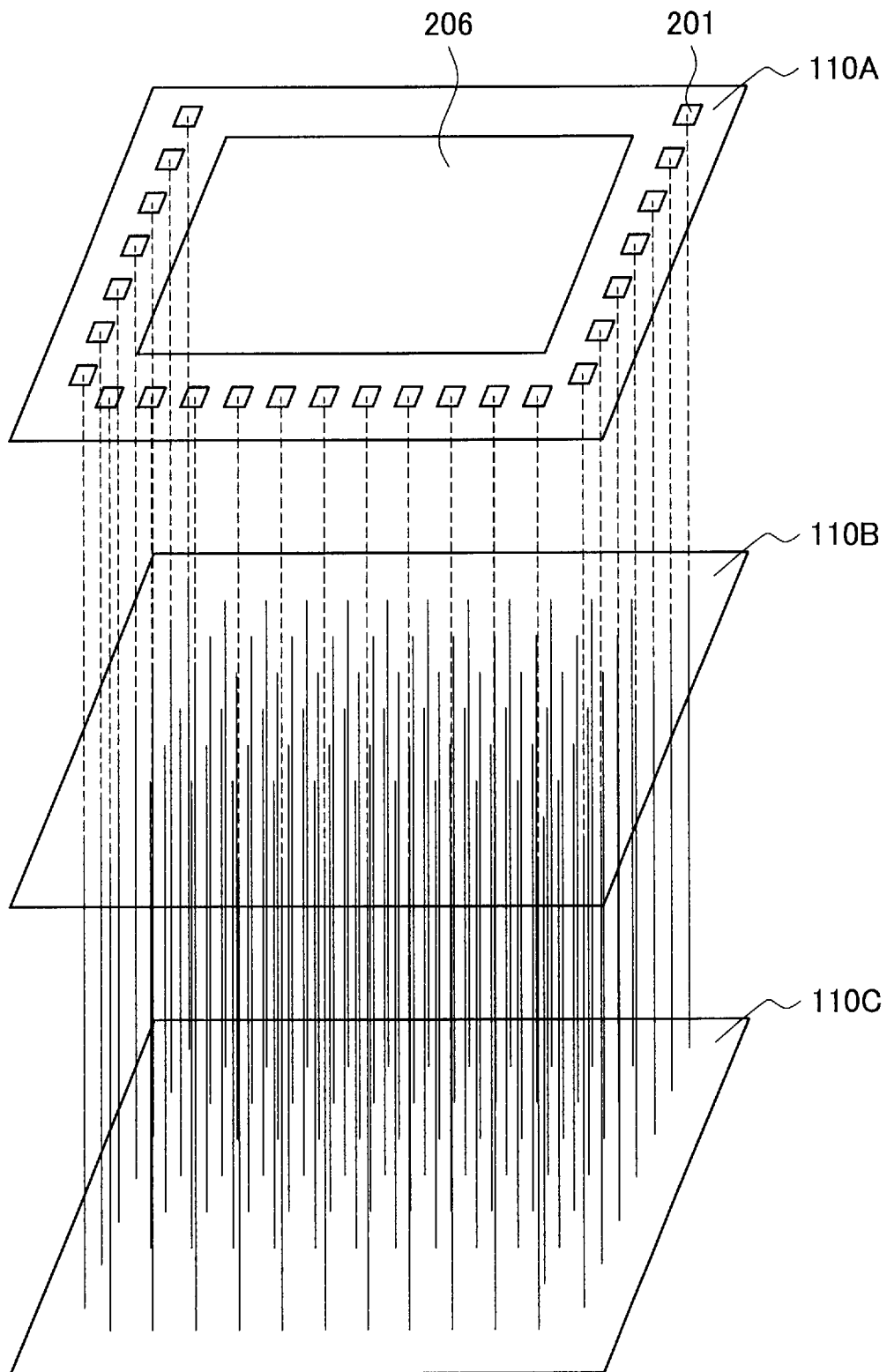
前記第1の接続構造は、前記第1多層配線層内の所定の配線を露出
させる第1の貫通孔と、前記第2多層配線層内の所定の配線を露出さ
せる前記第1の貫通孔とは異なる第2の貫通孔と、に導電材料が埋め
込まれた構造、又は前記第1の貫通孔及び前記第2の貫通孔の内壁に
導電材料が成膜された構造、を有するビア、を含む、

電子機器。

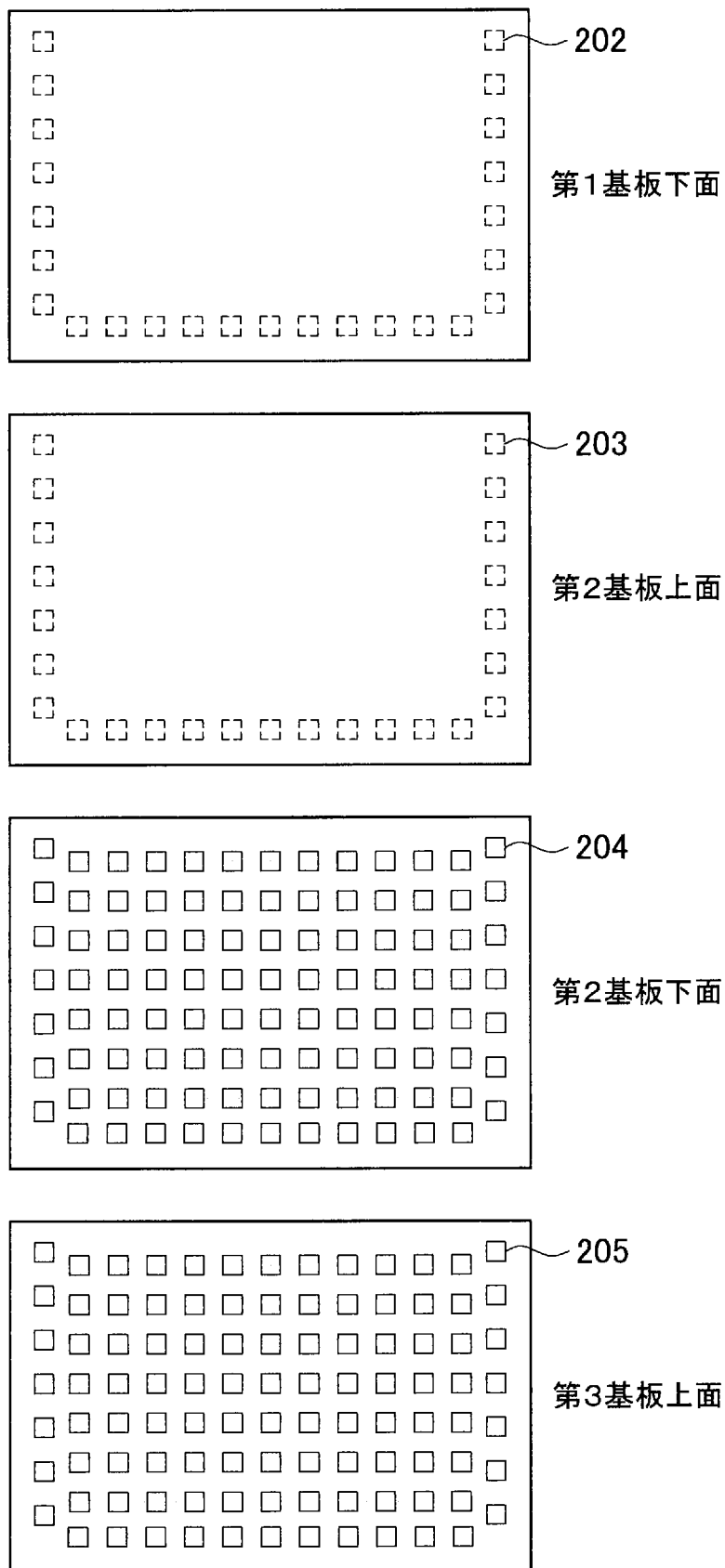
[図1]



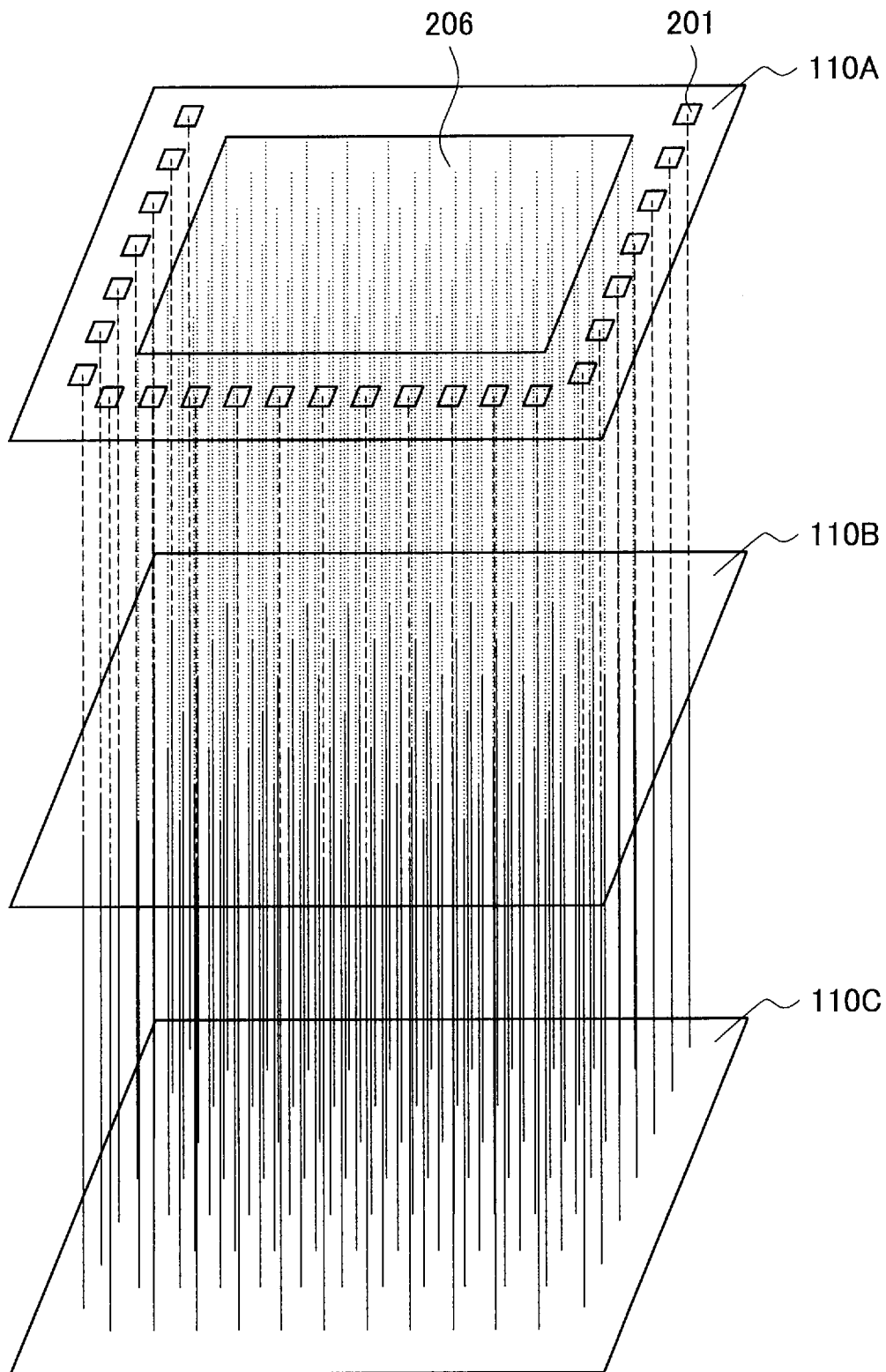
[図2A]



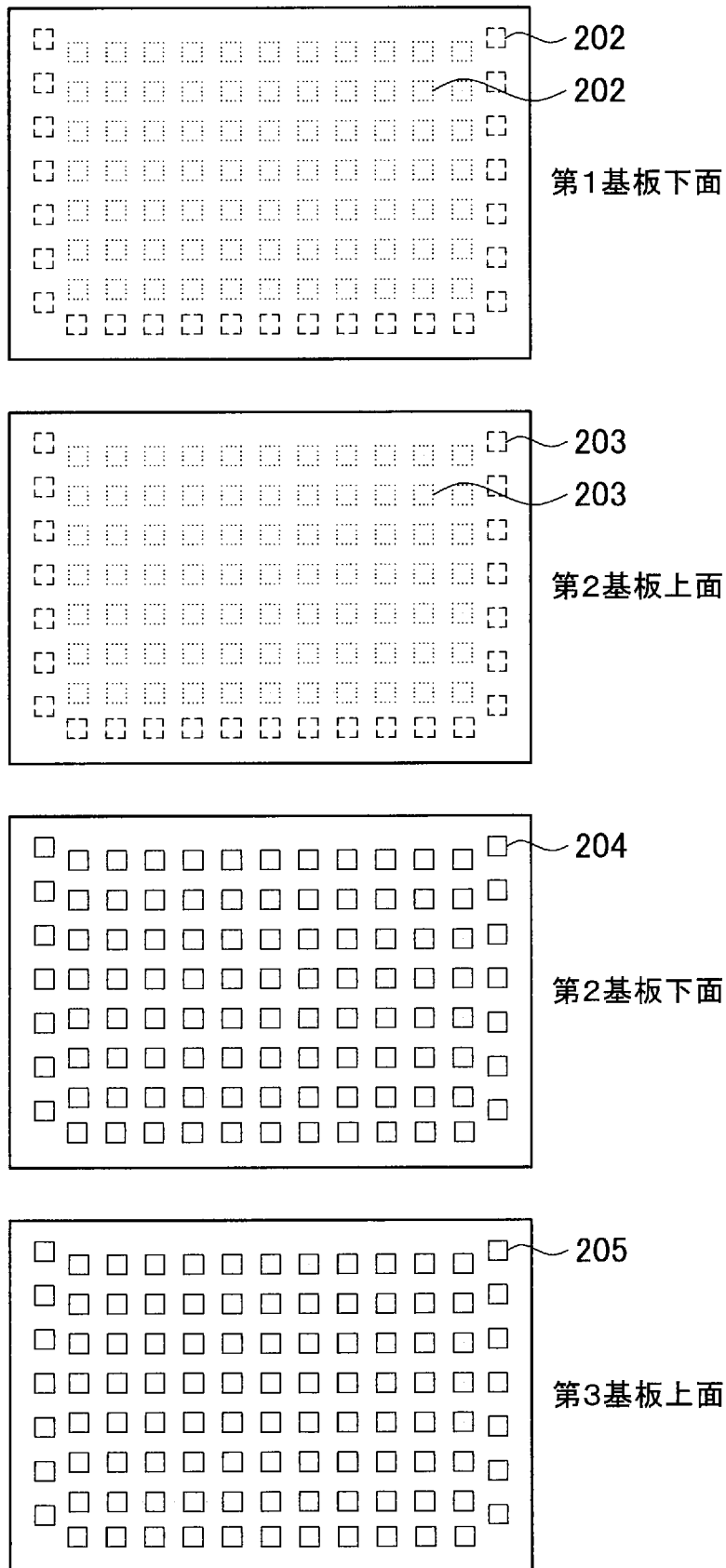
[図2B]



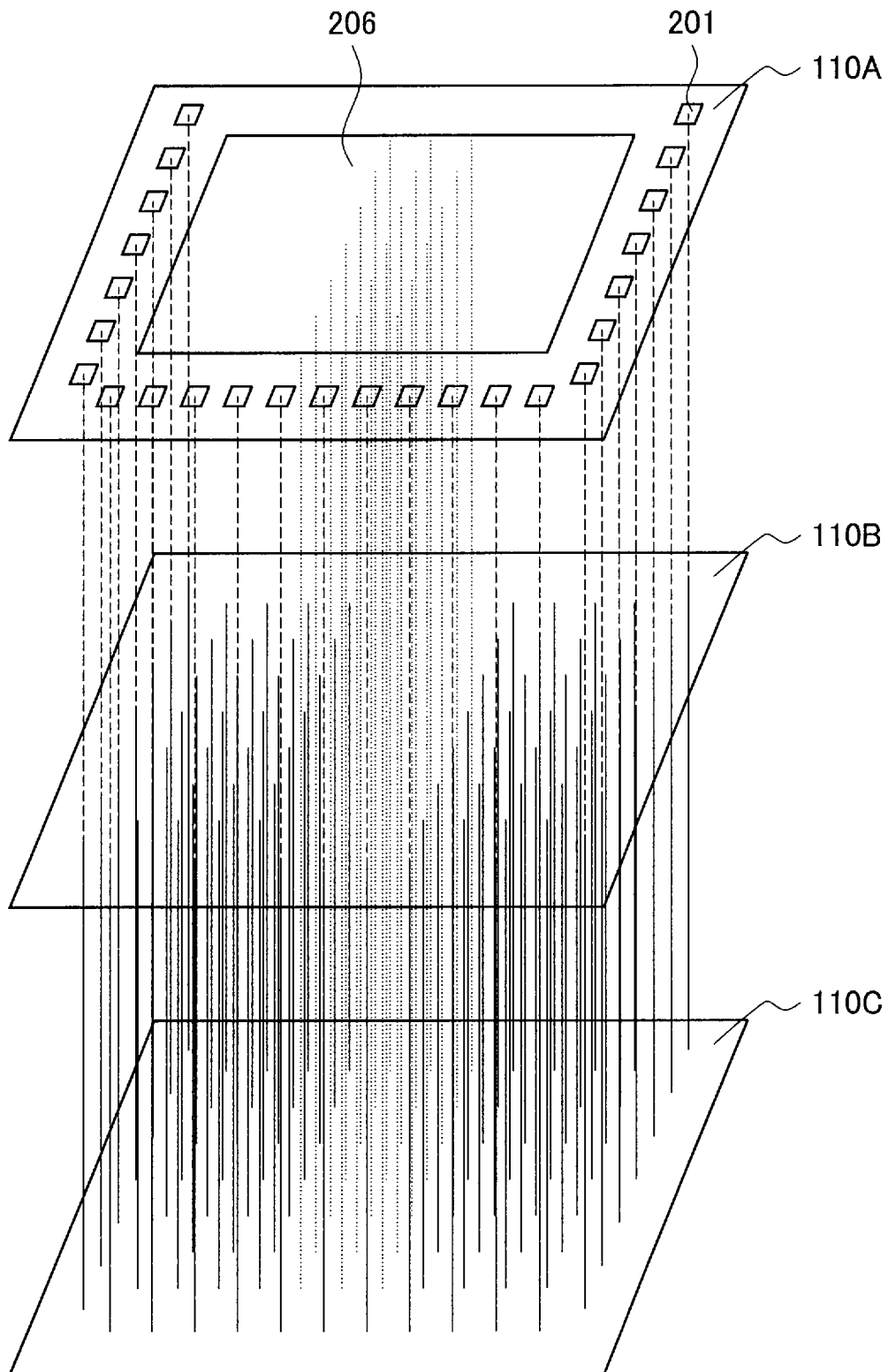
[図2C]



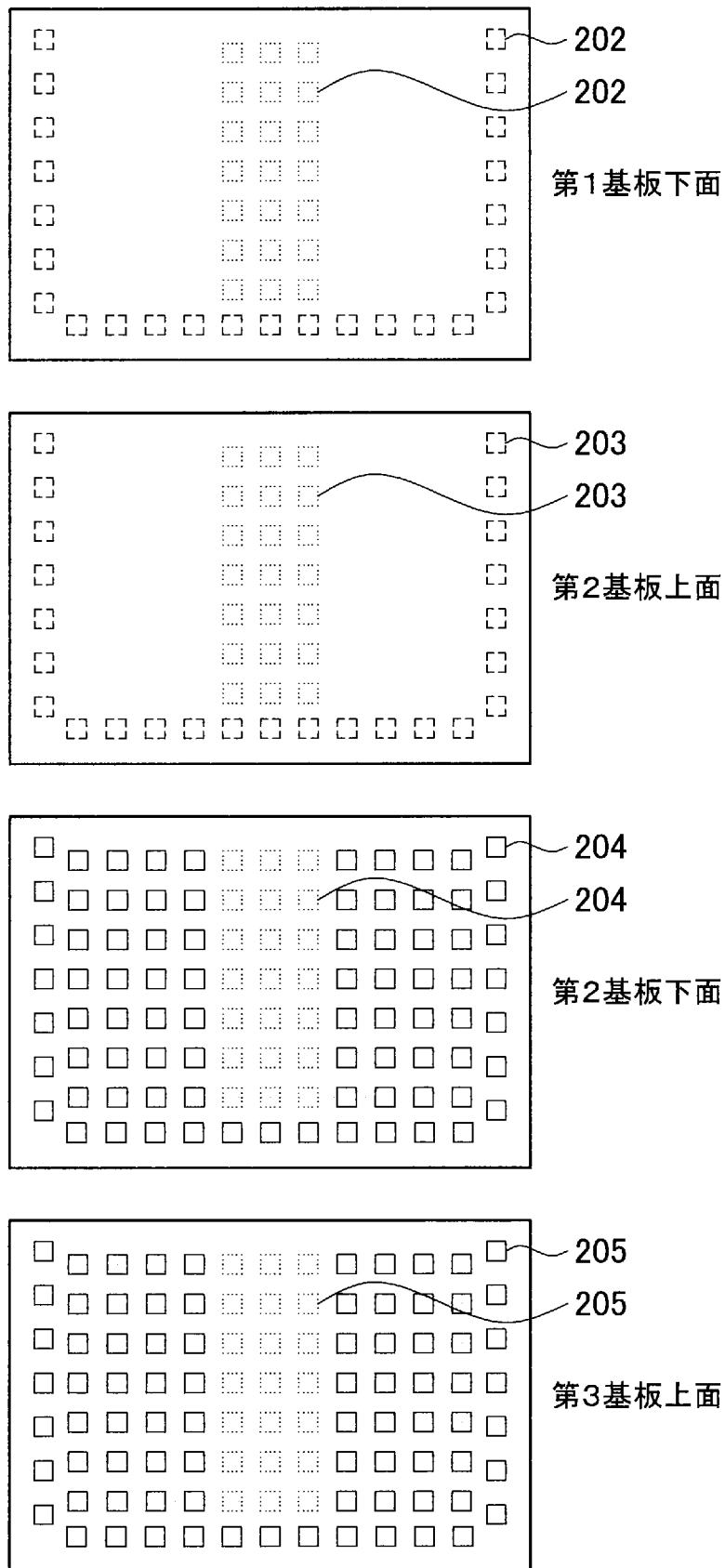
[図2D]



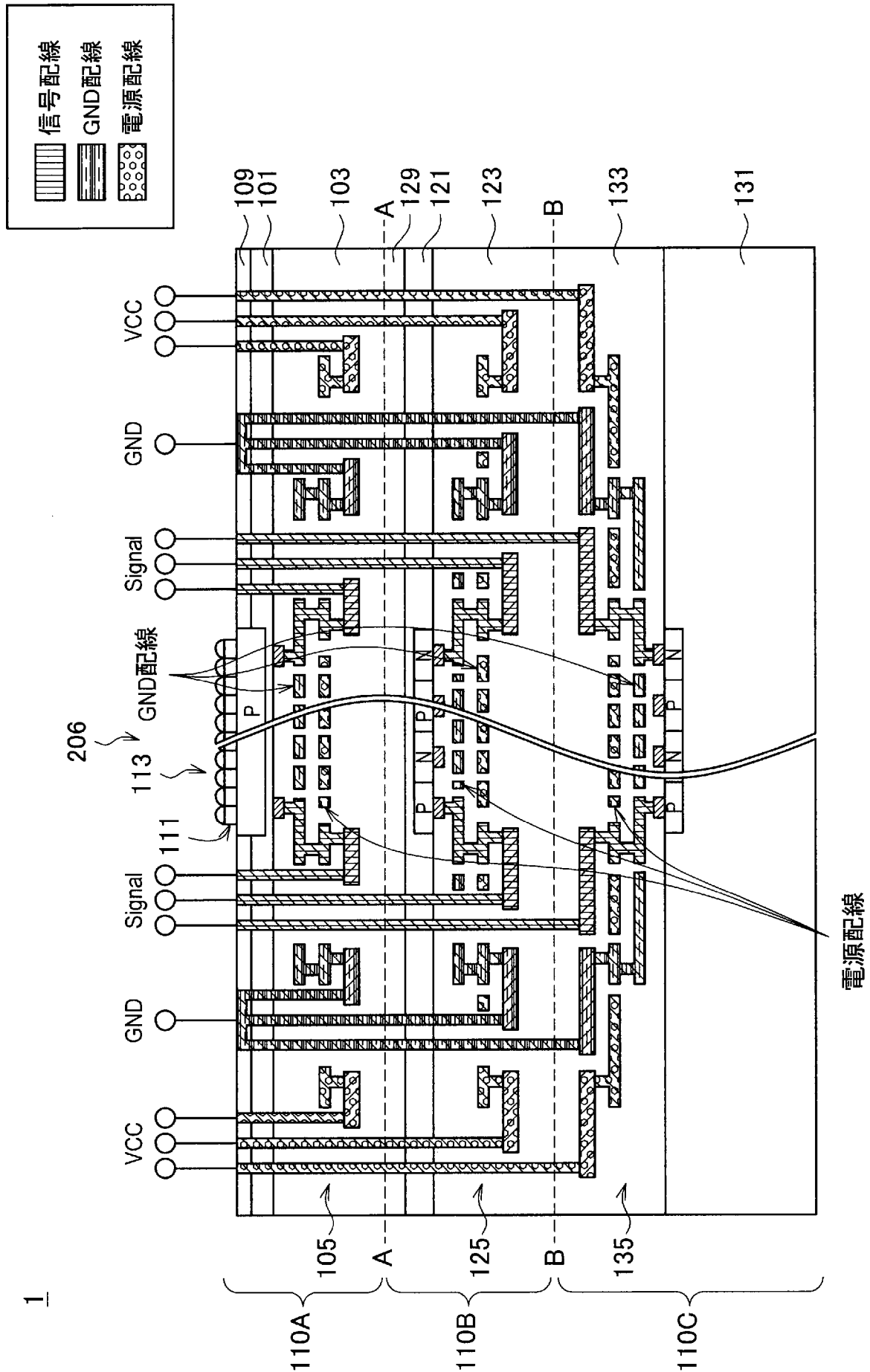
[図2E]

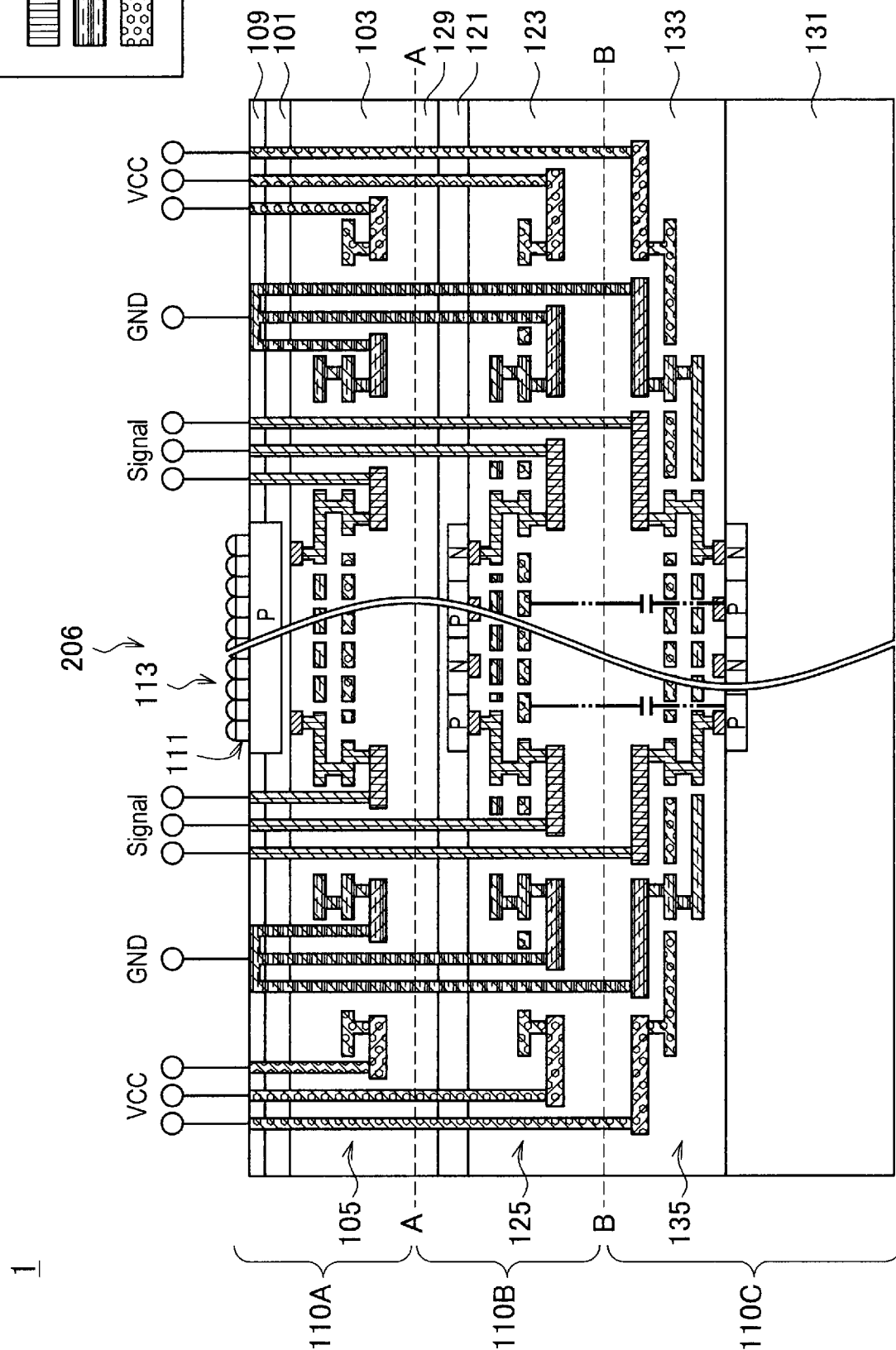


[図2F]



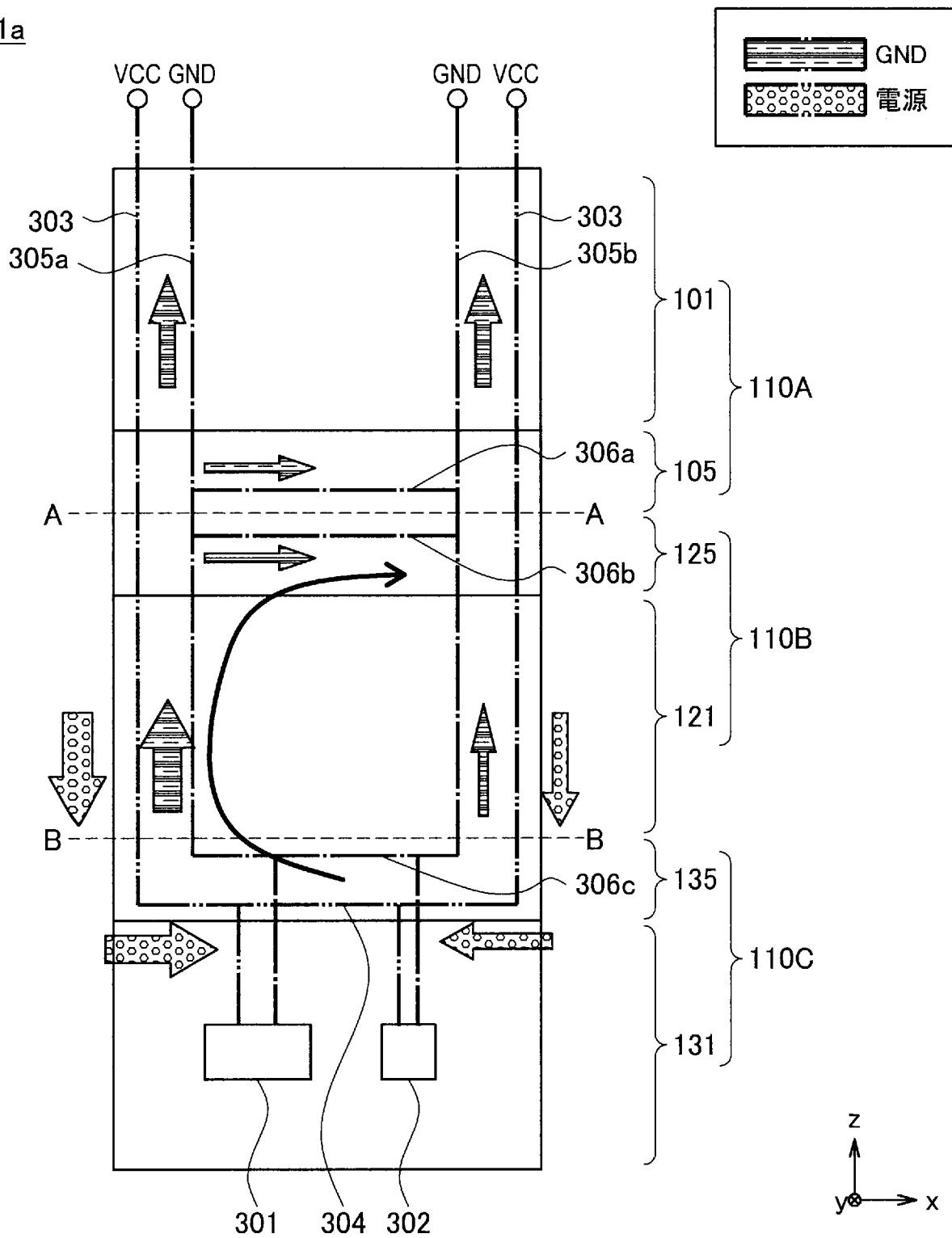
[図3B]





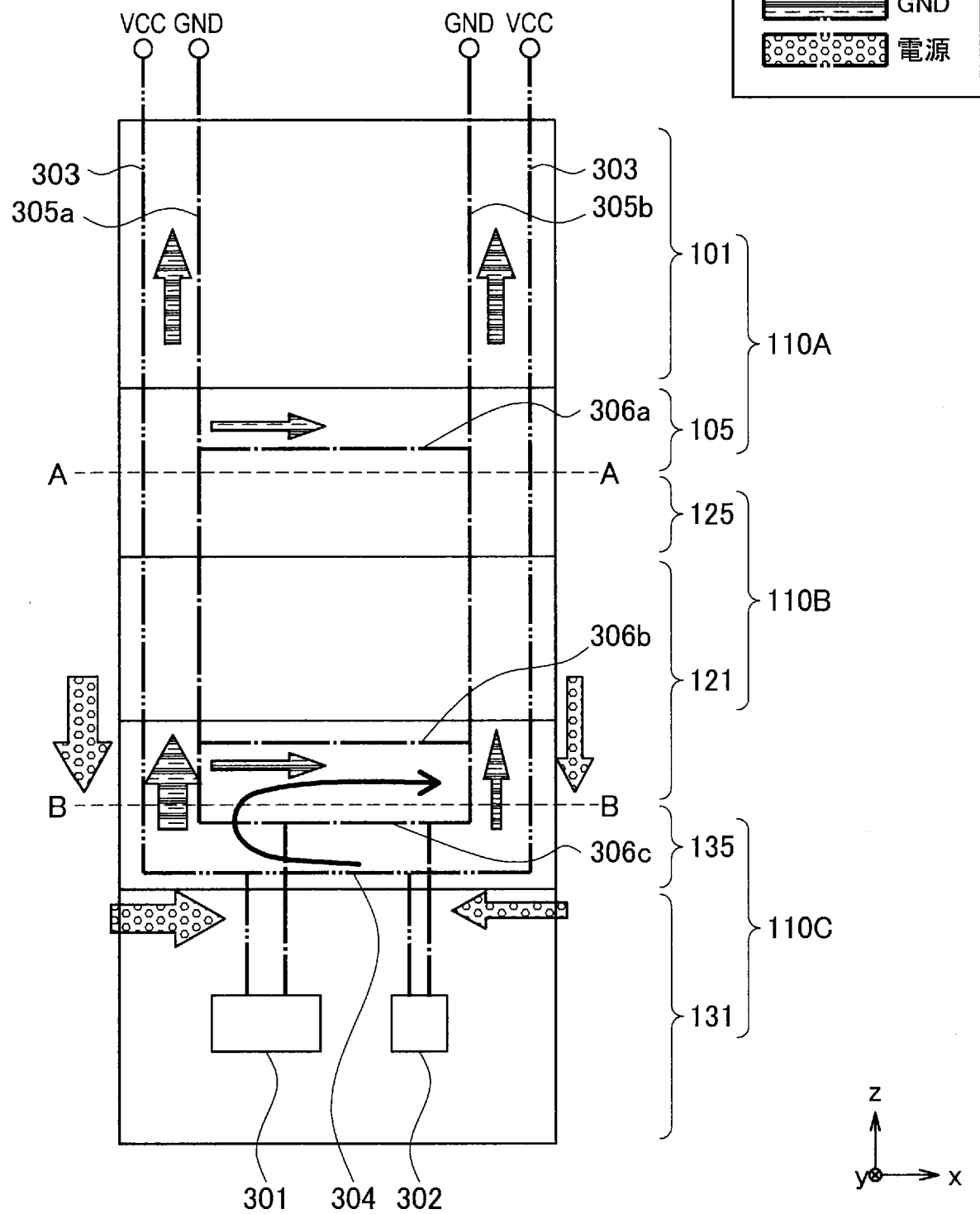
[図5A]

1a



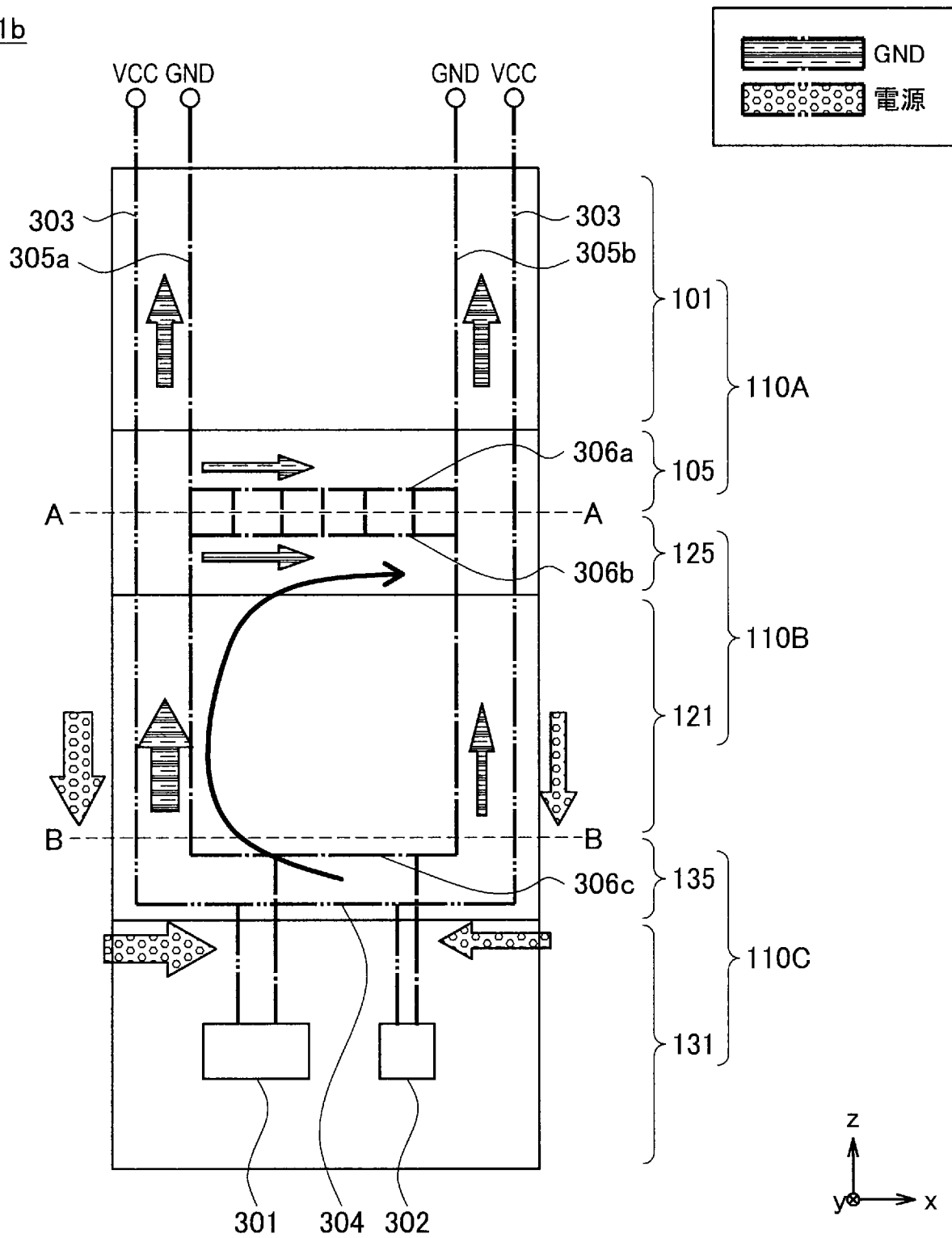
[図5B]

1



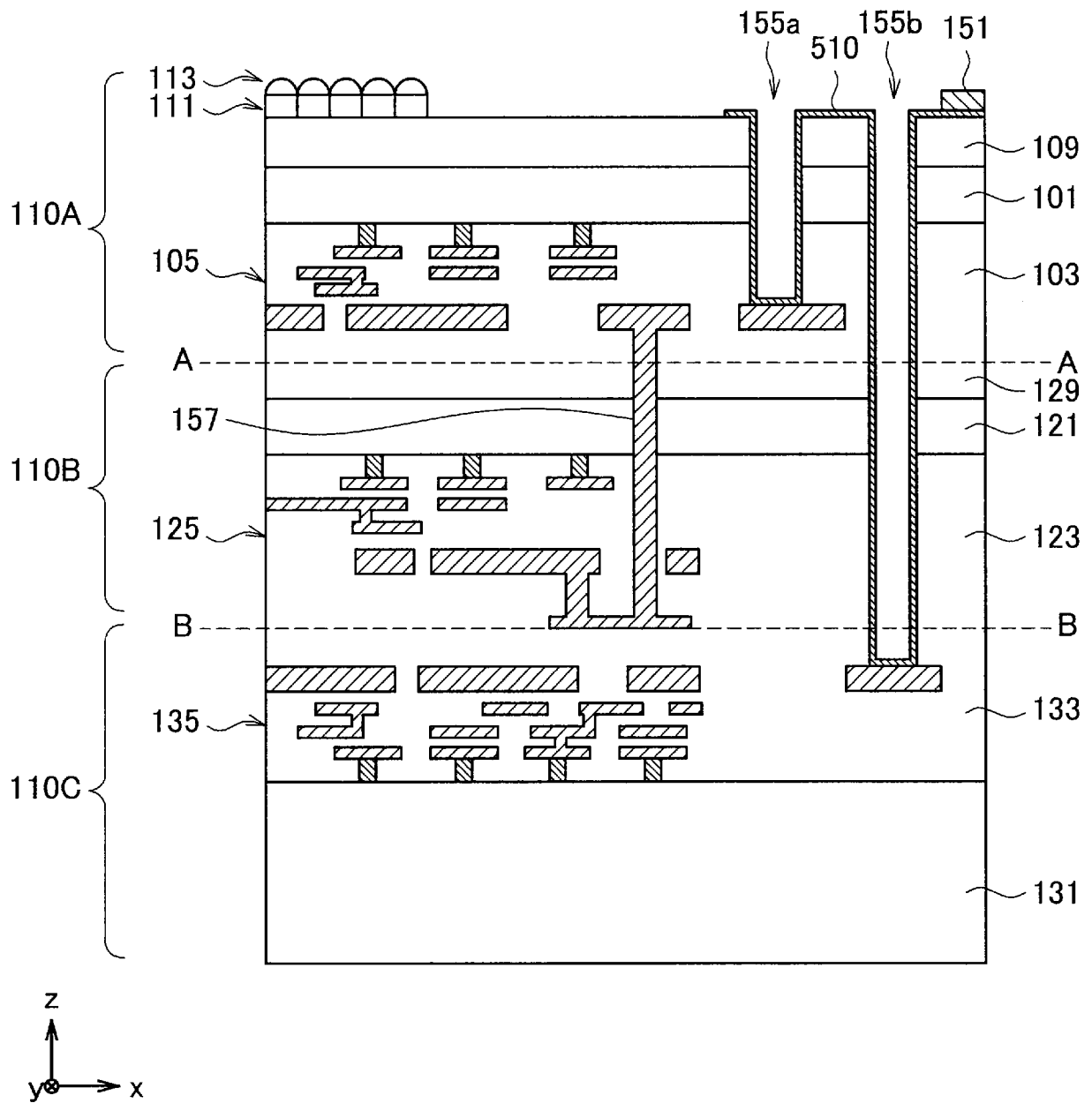
[図5C]

1b

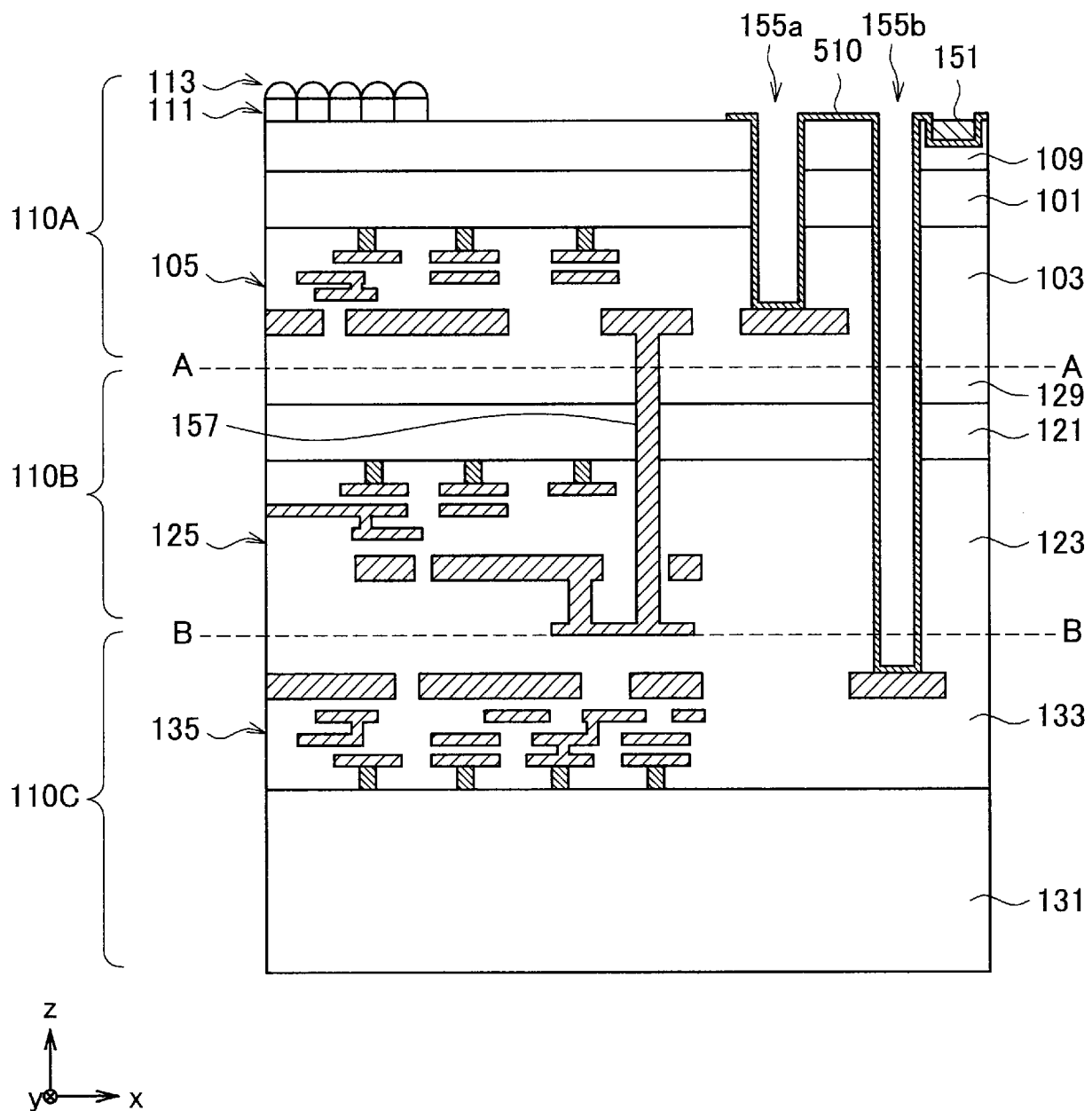


[図6A]

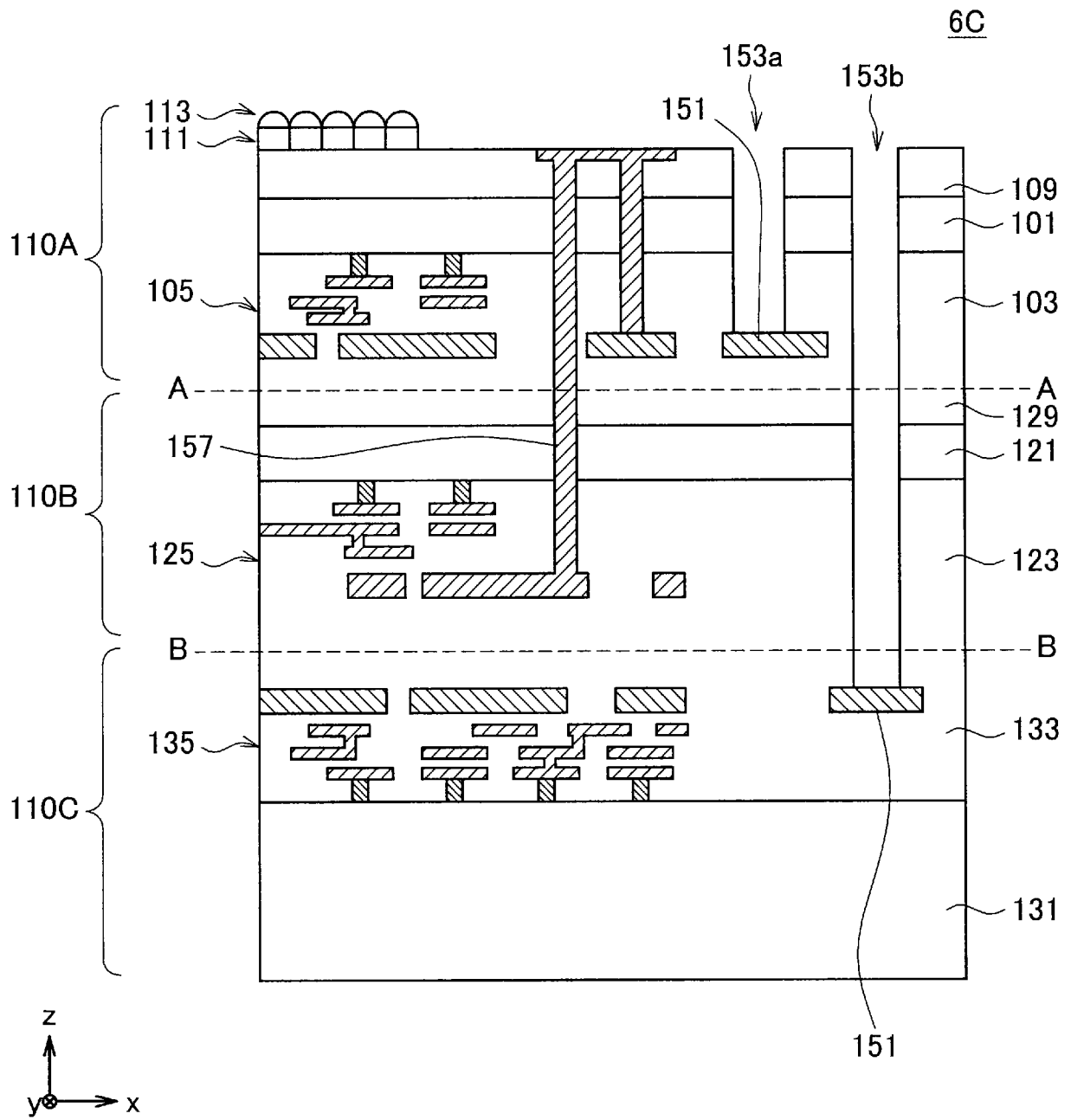
6A



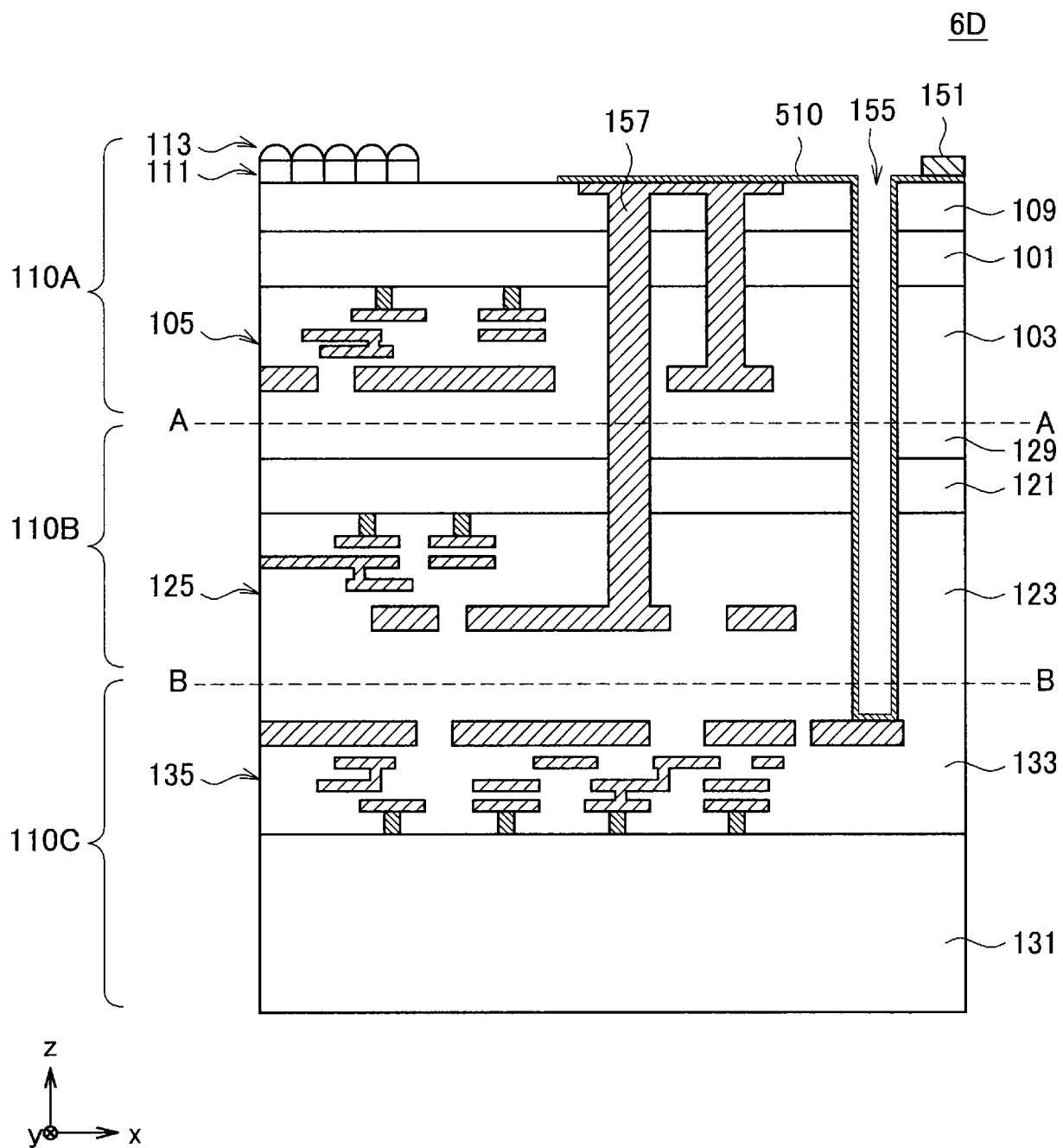
[図6B]

6B

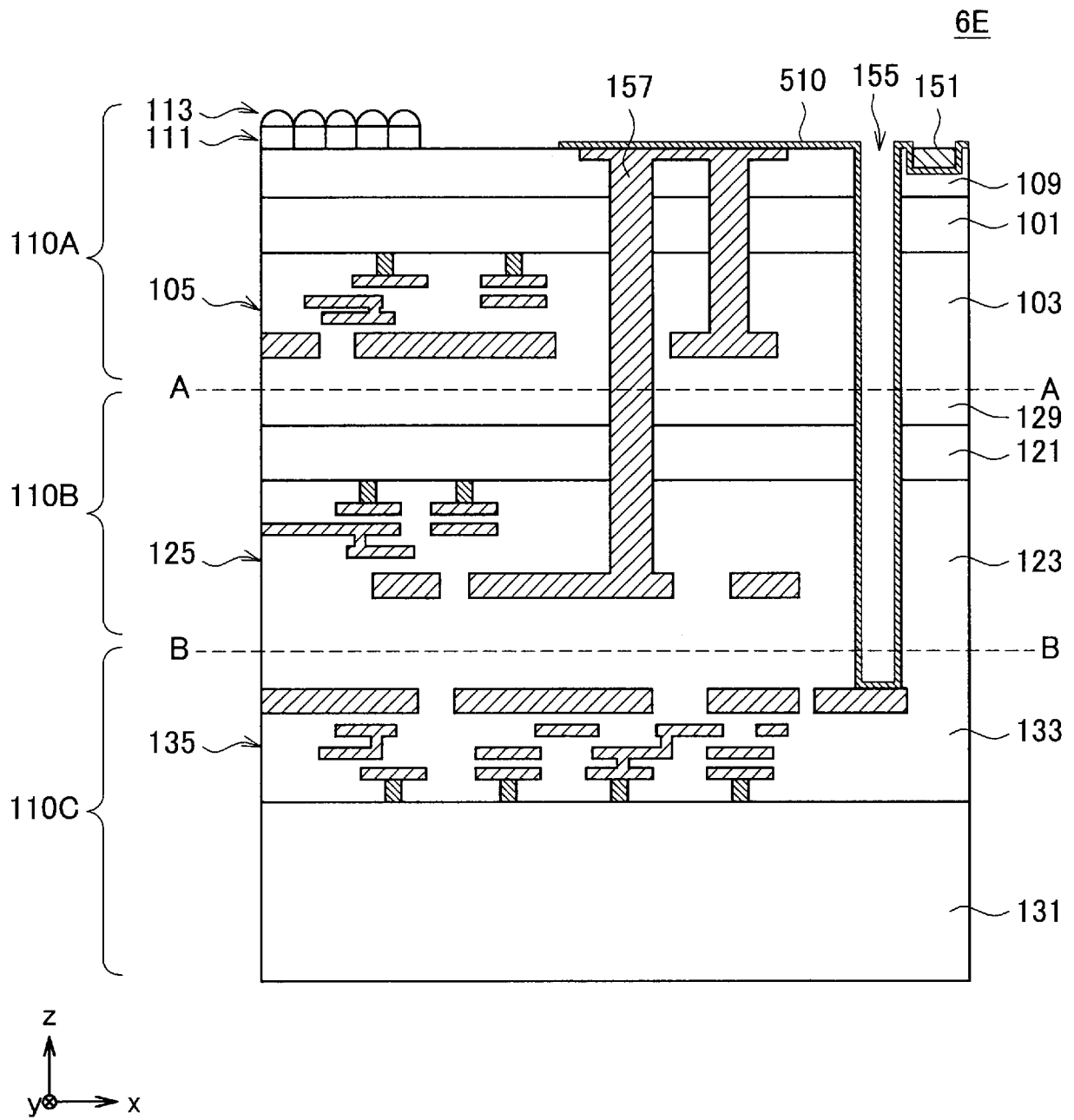
[図6C]



[図6D]

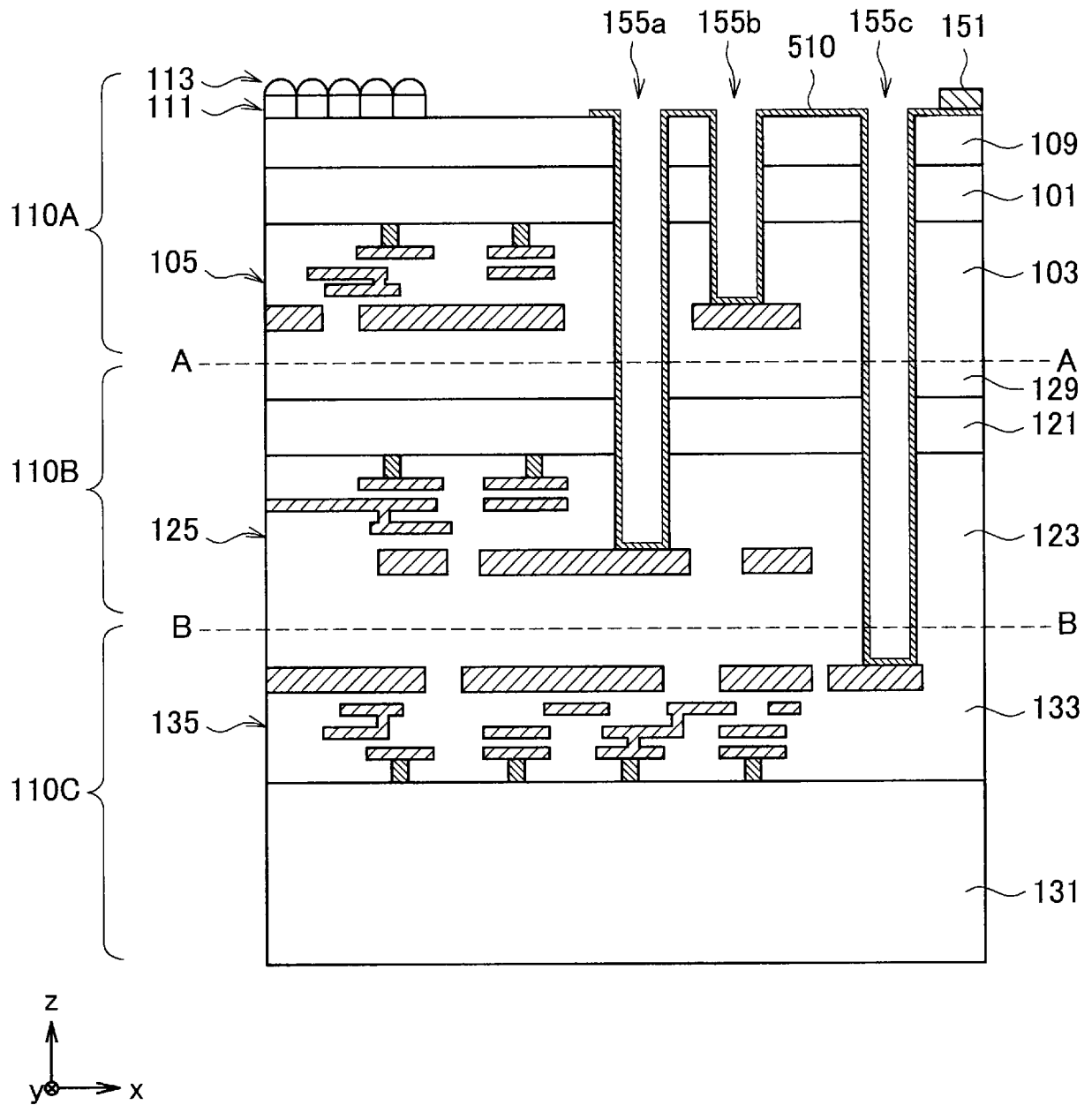


[図6E]

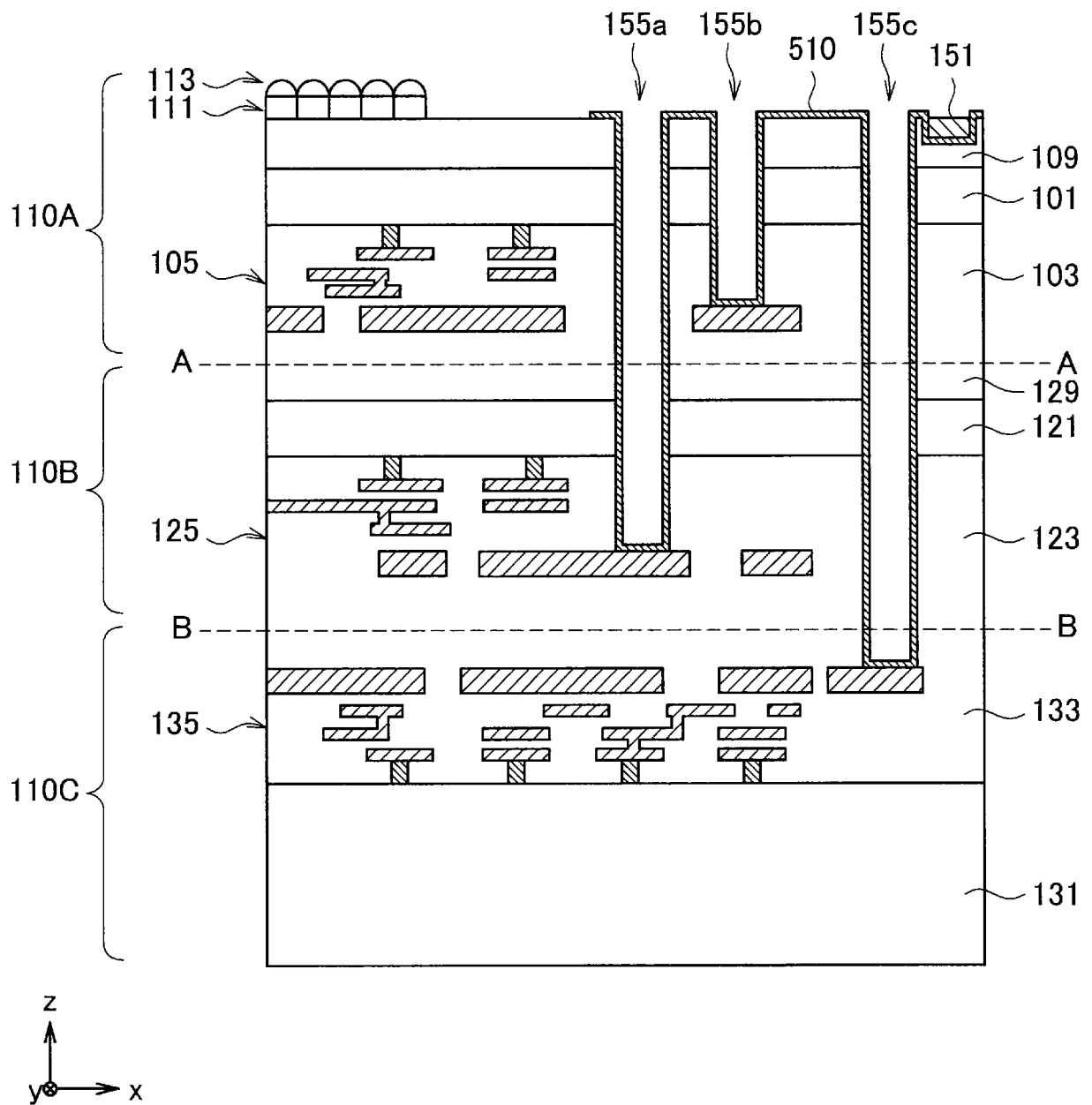


[図6F]

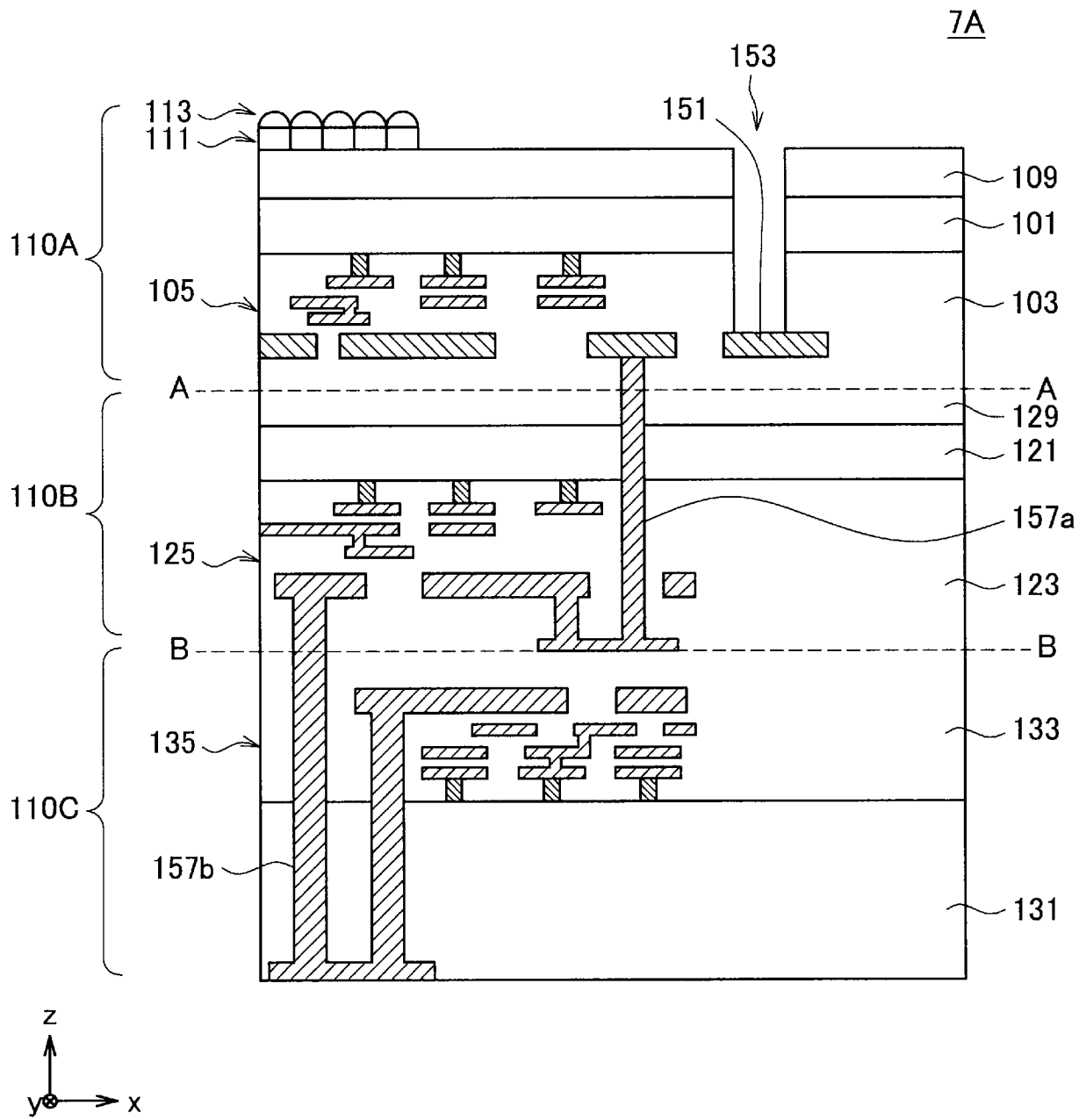
6F



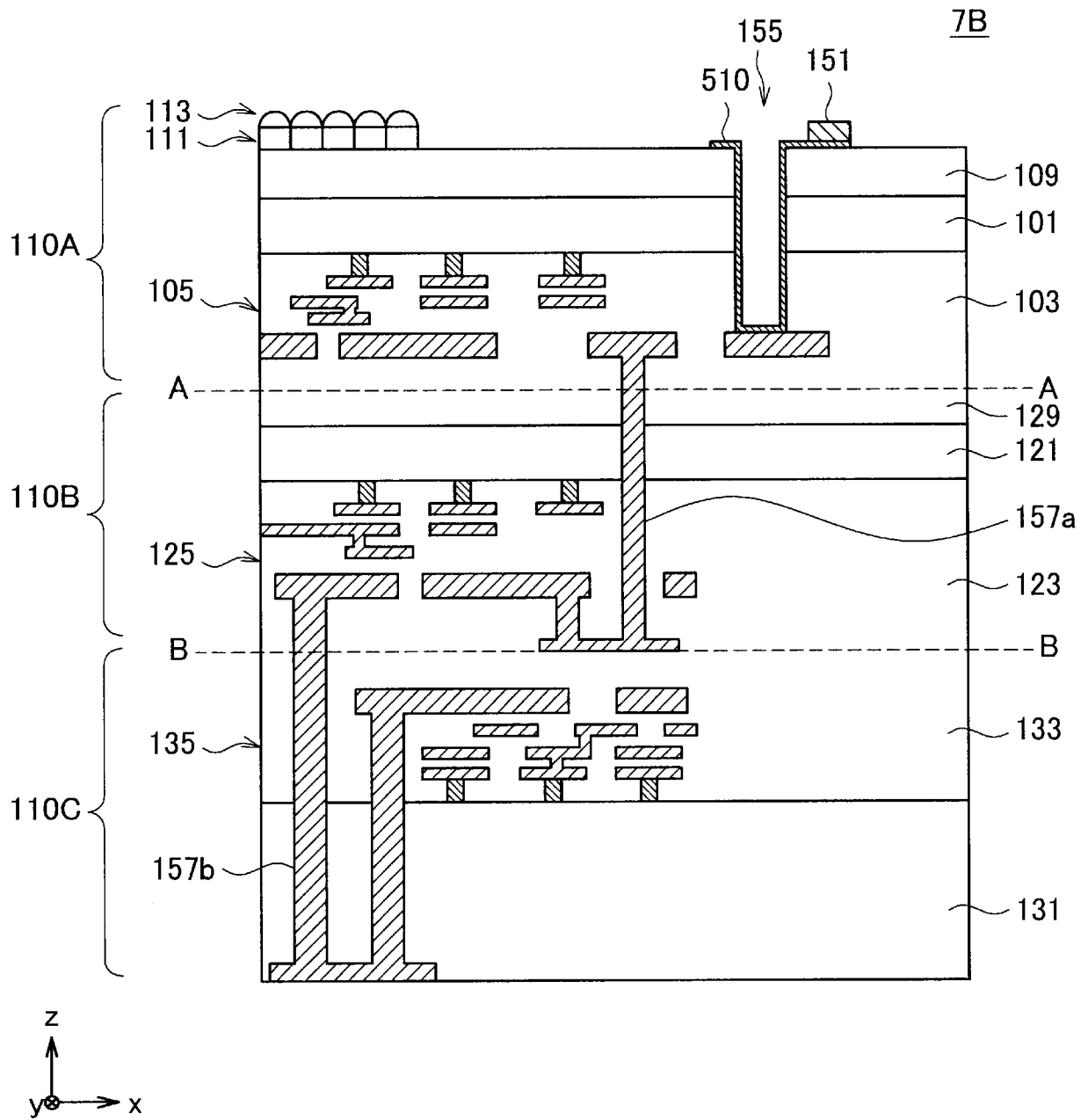
[図6G]

6G

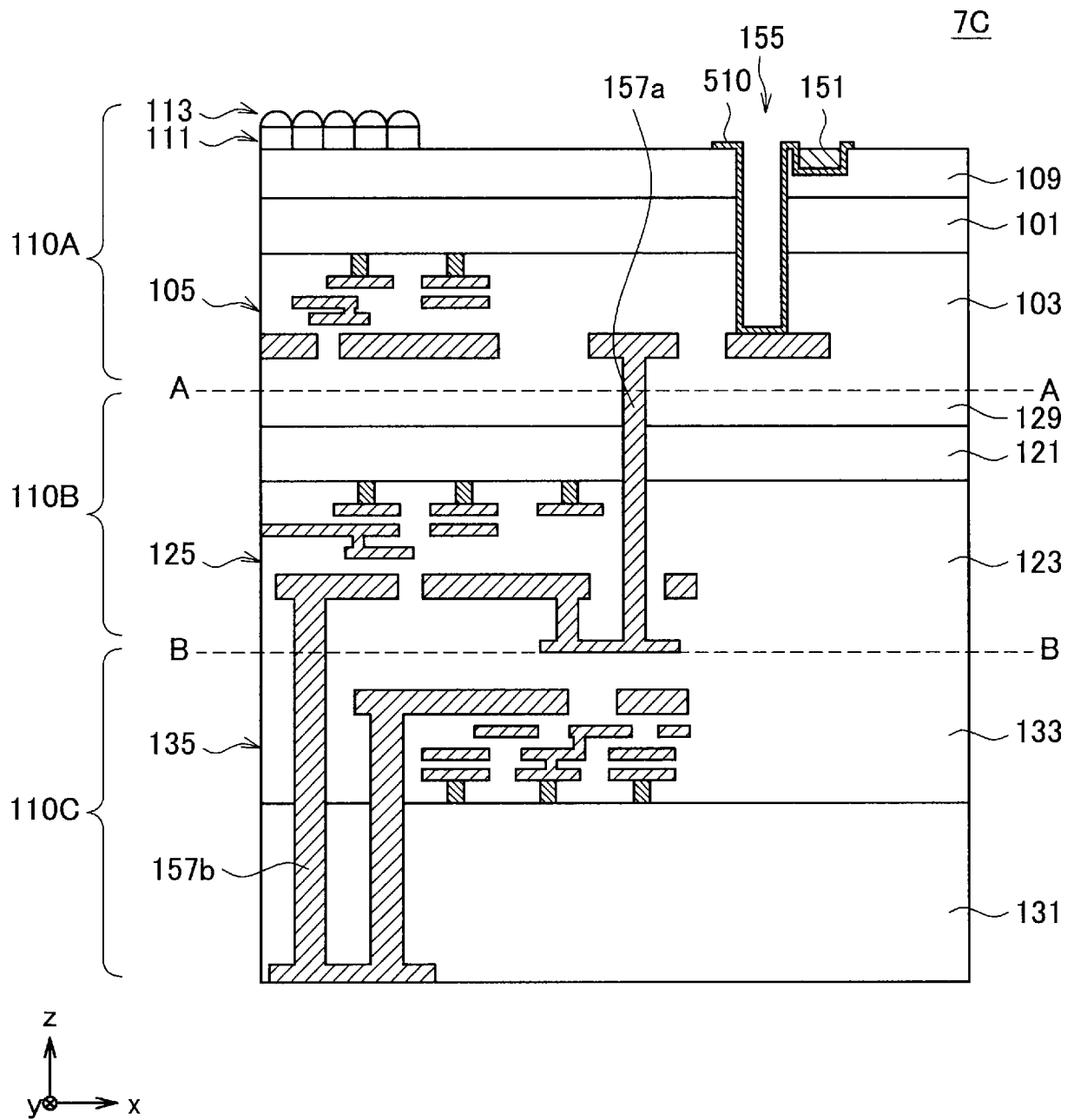
[図7A]

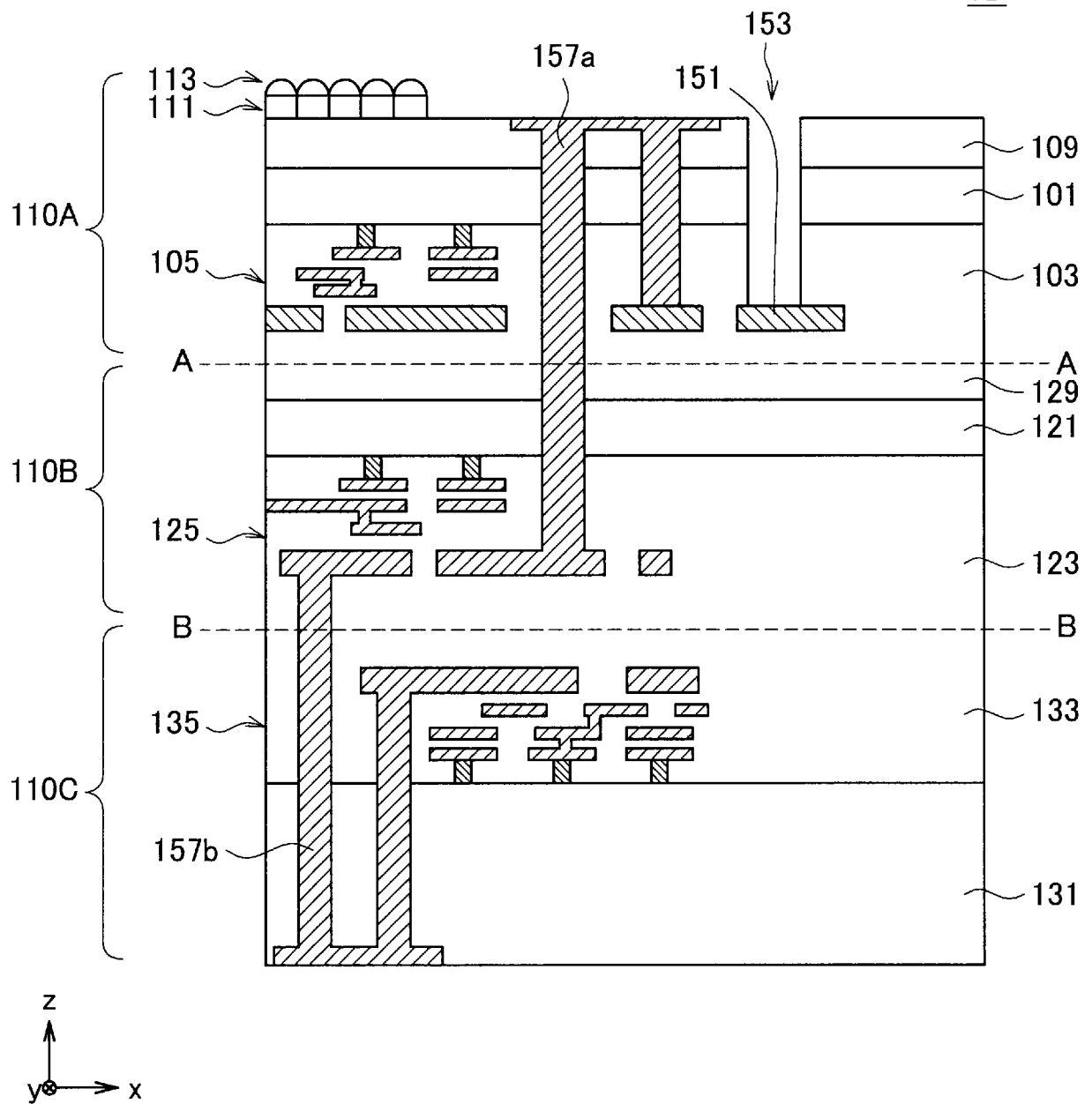


[図7B]

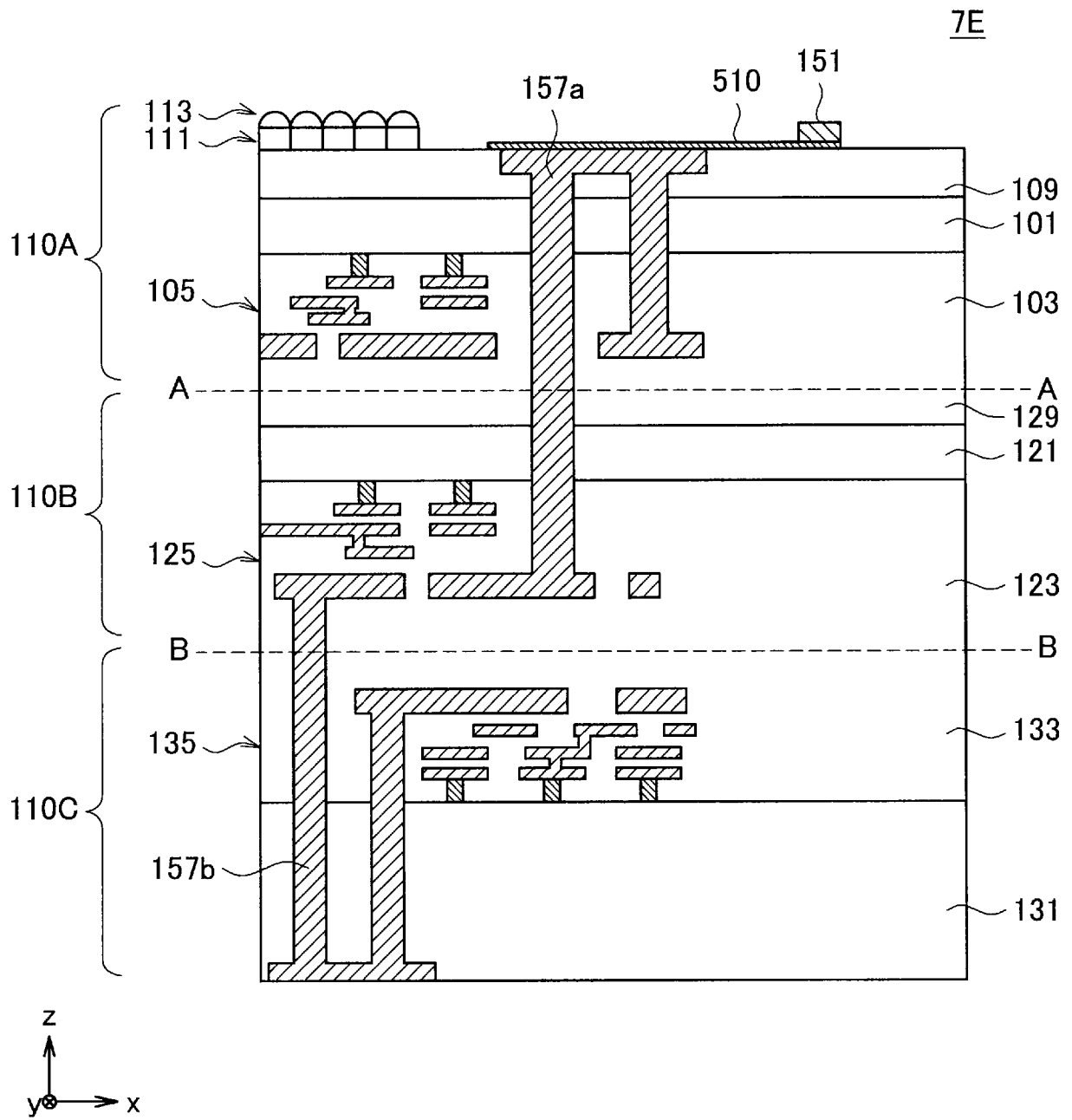


[図7C]

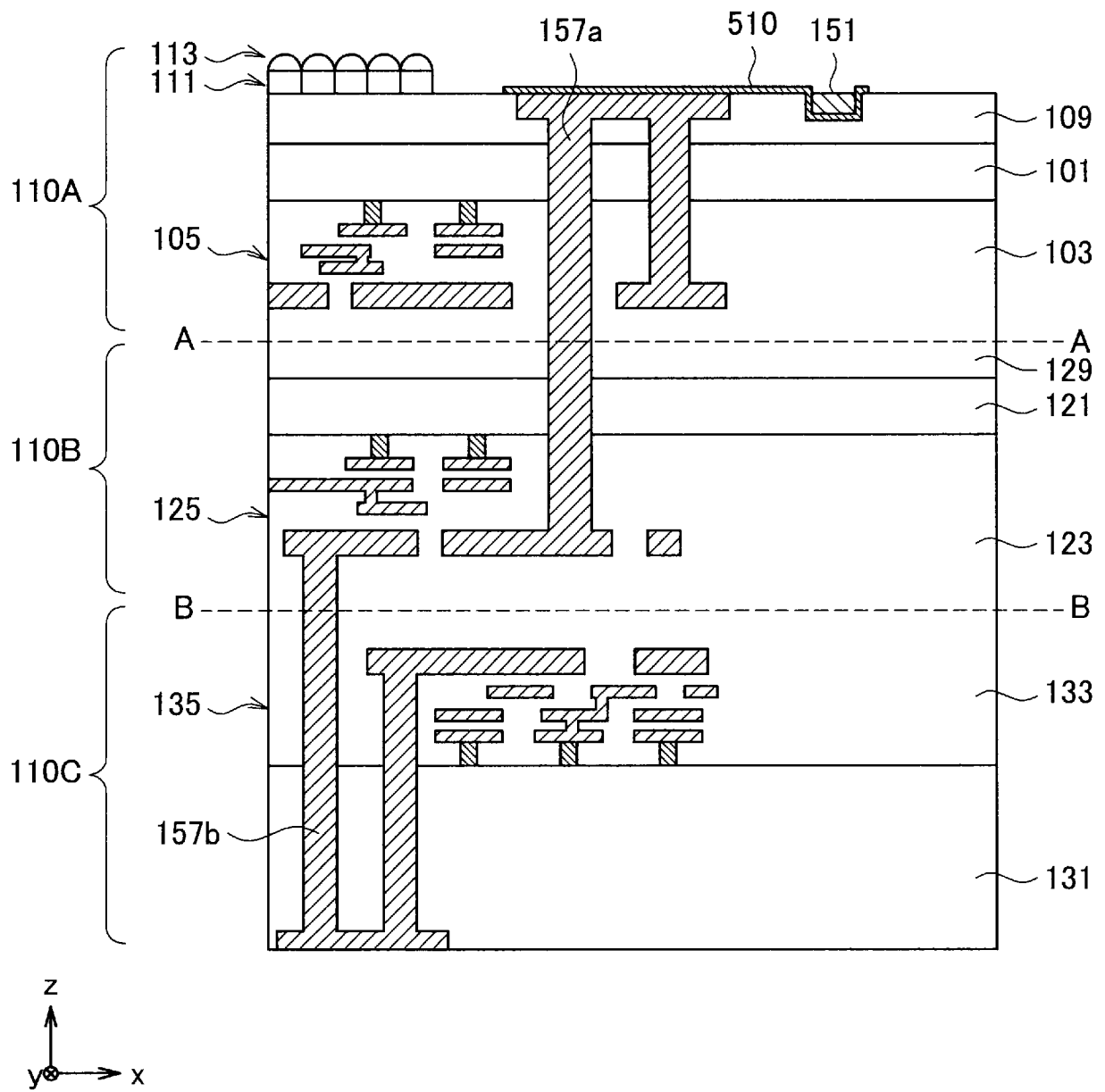


7D

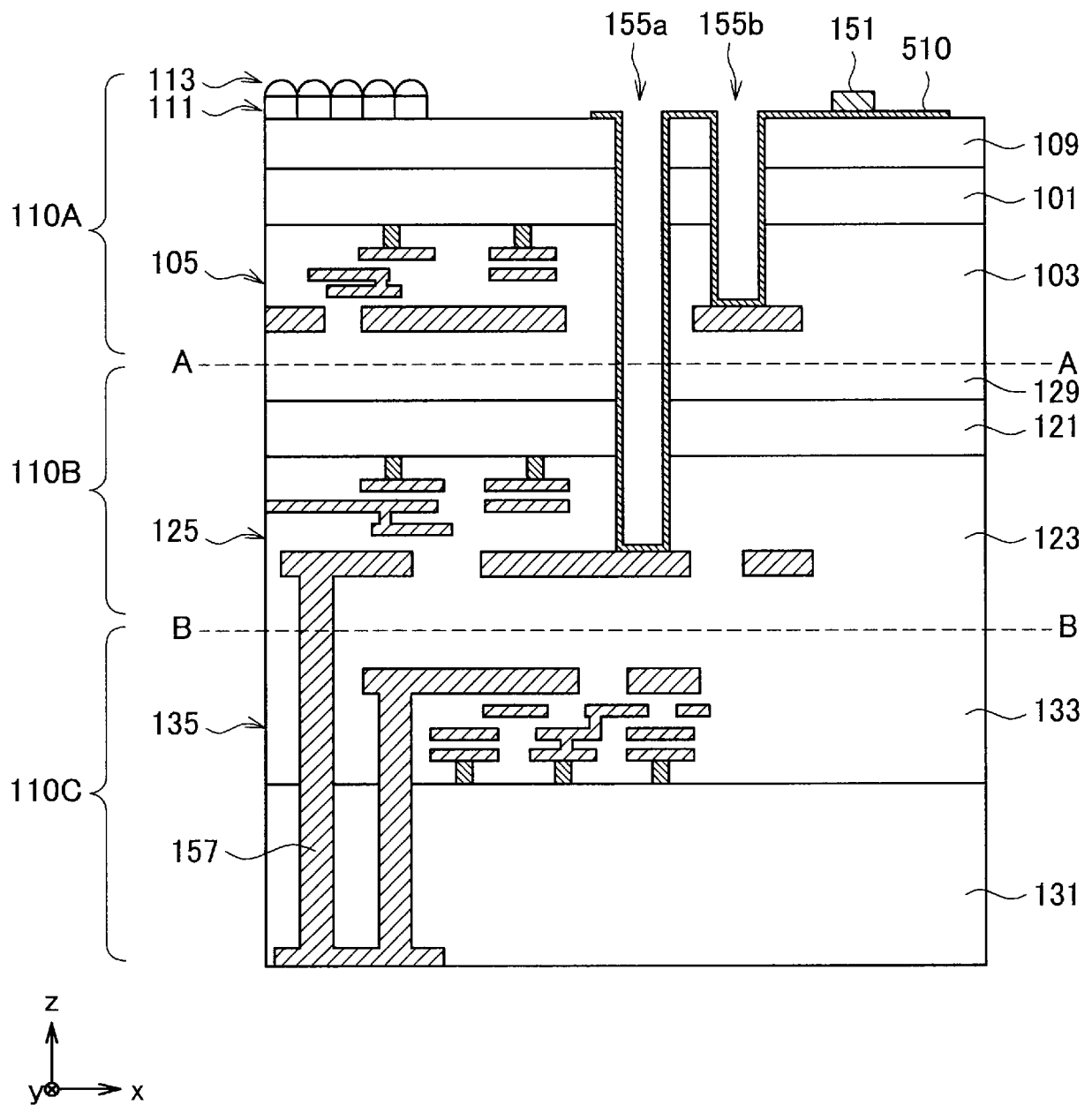
[図7E]



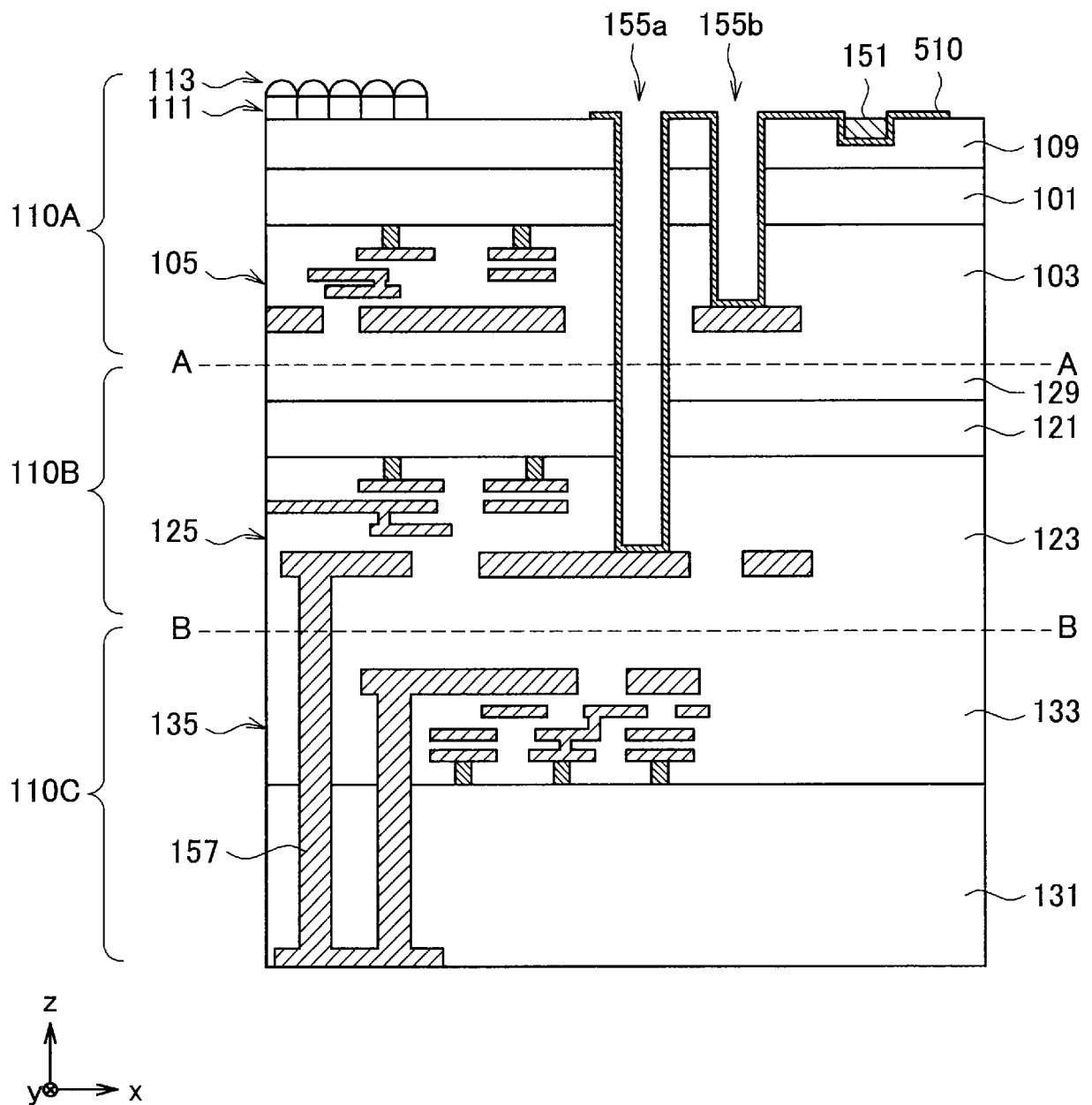
[図7F]

7F

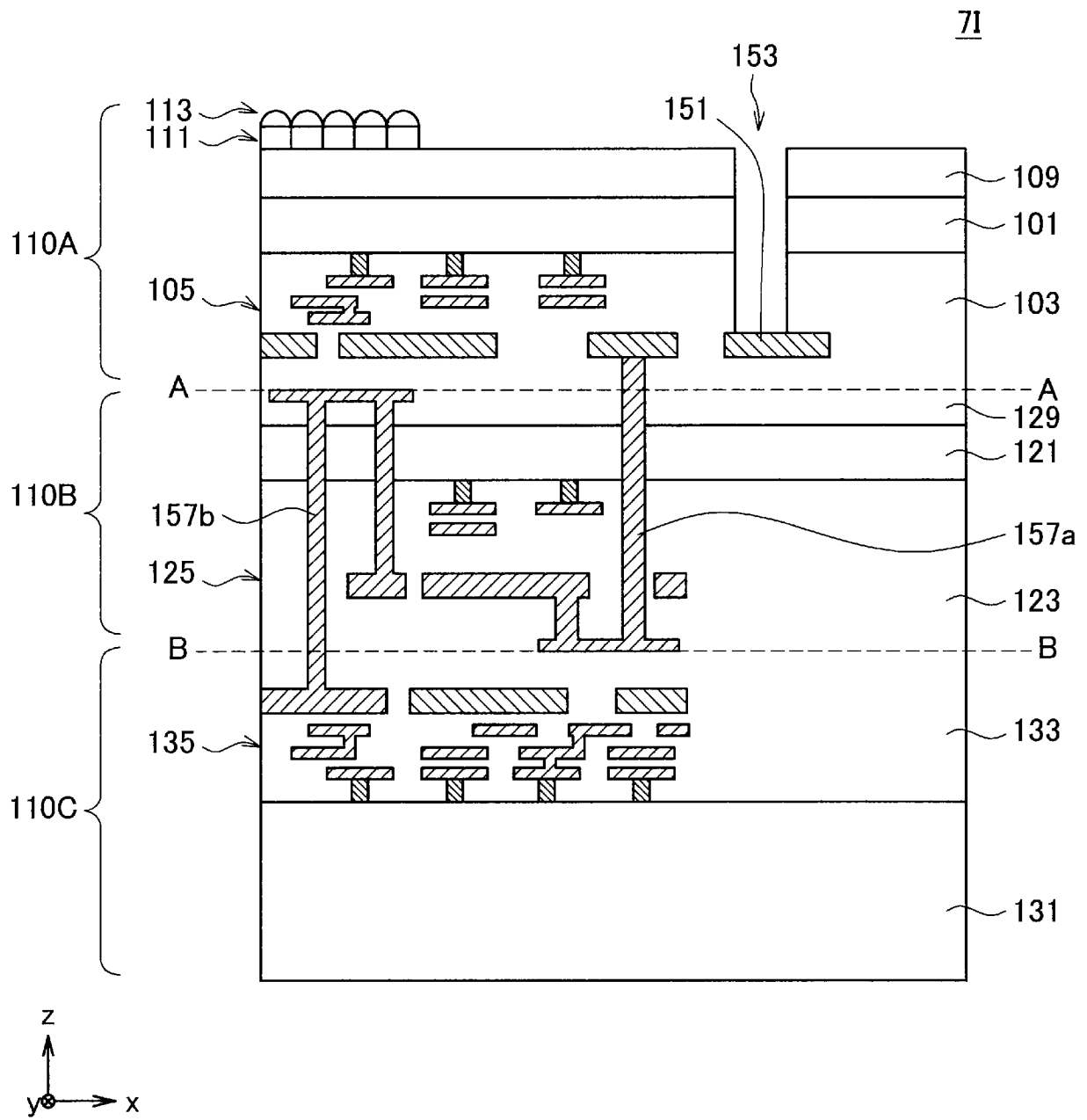
[図7G]

7G

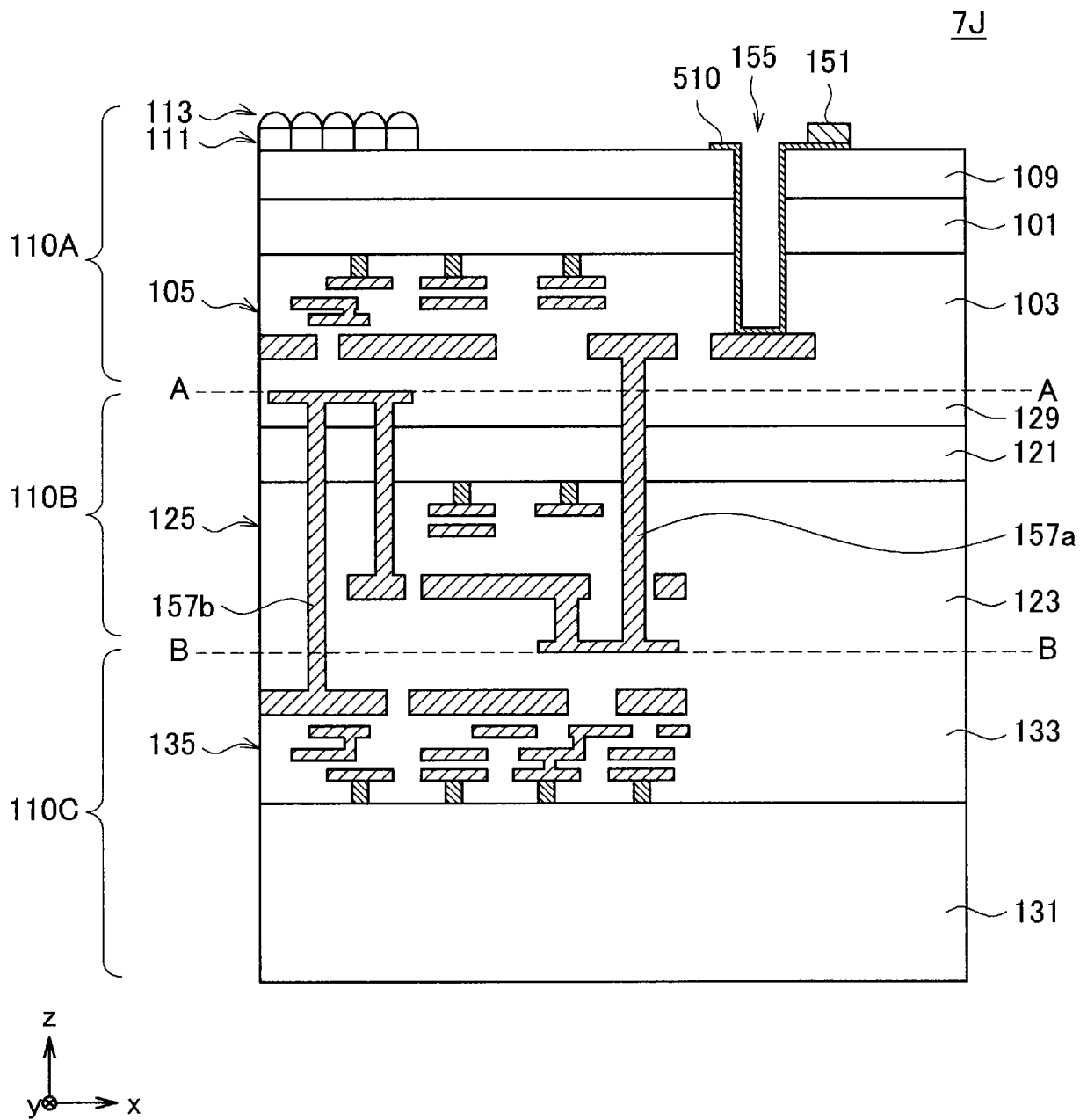
[図7H]

7H

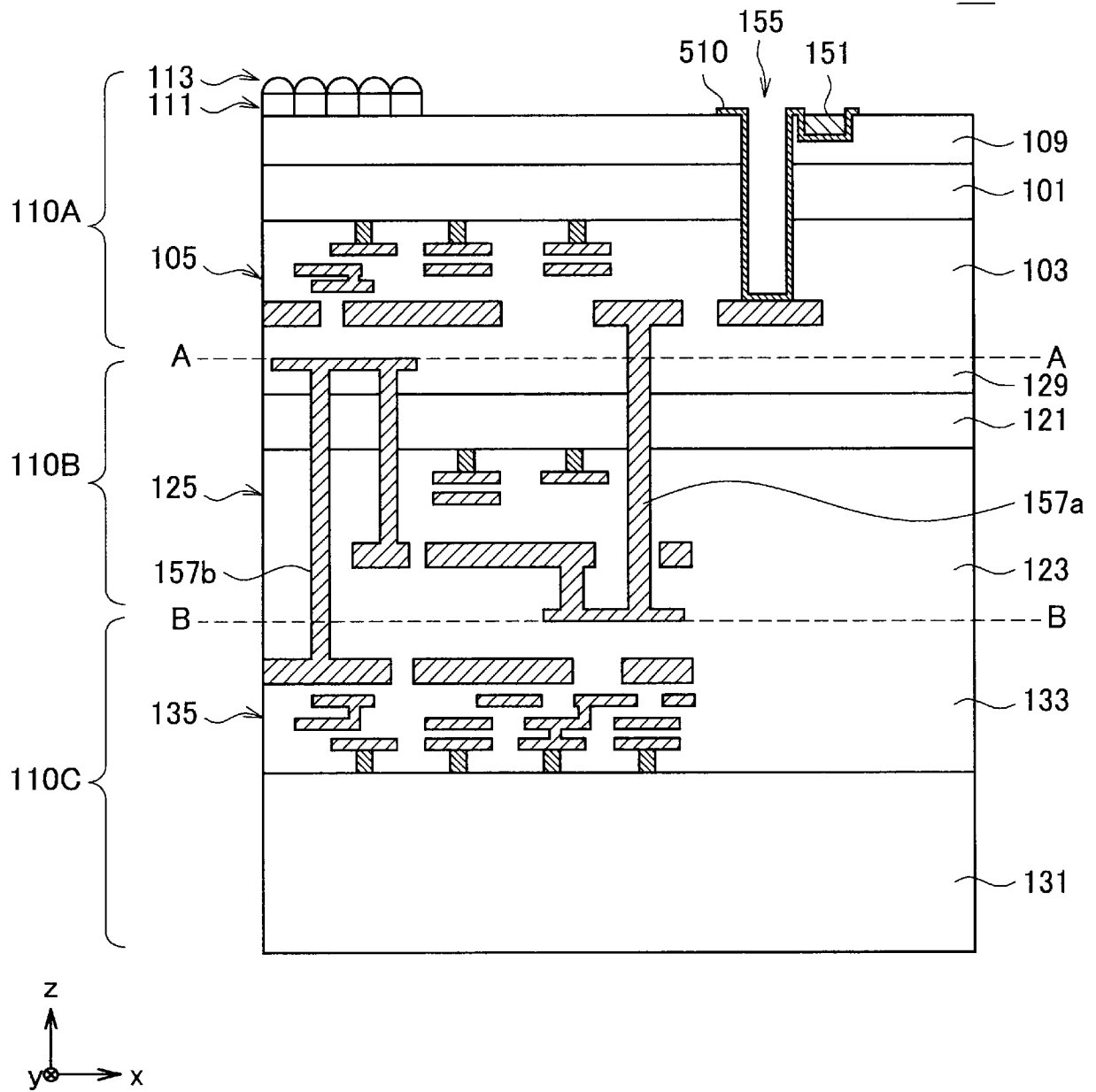
[図7I]



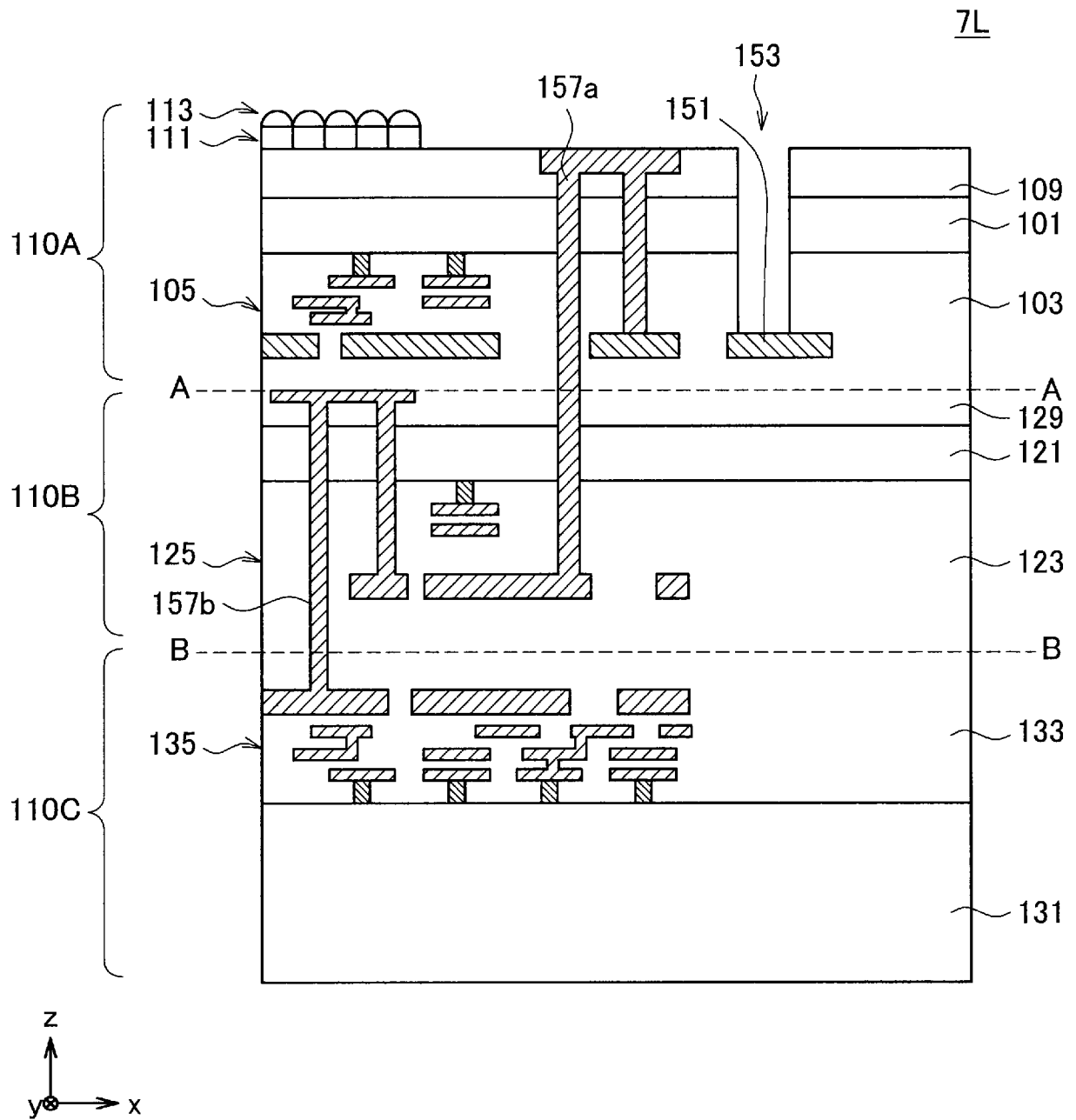
[図7J]



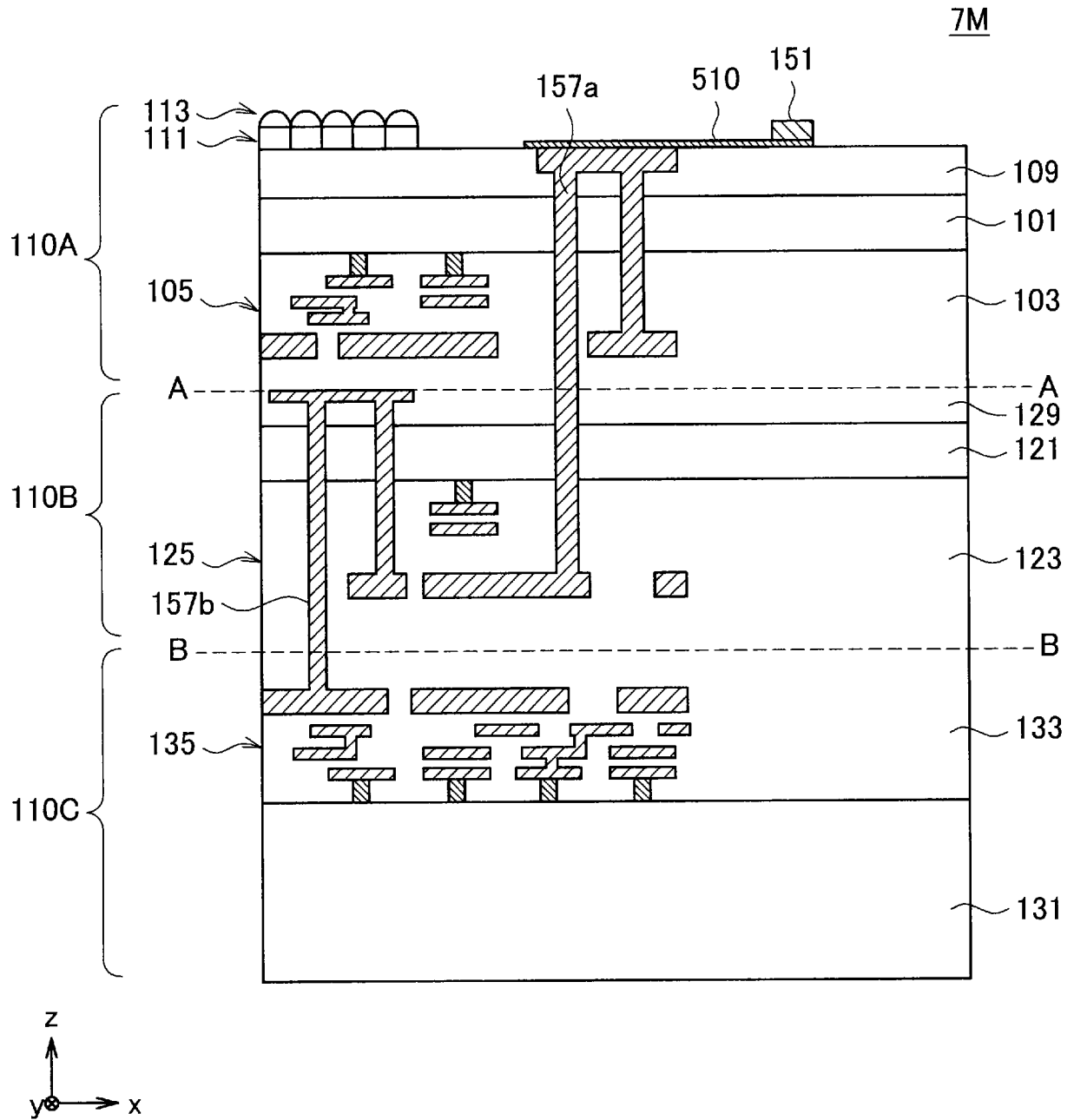
[図7K]

7K

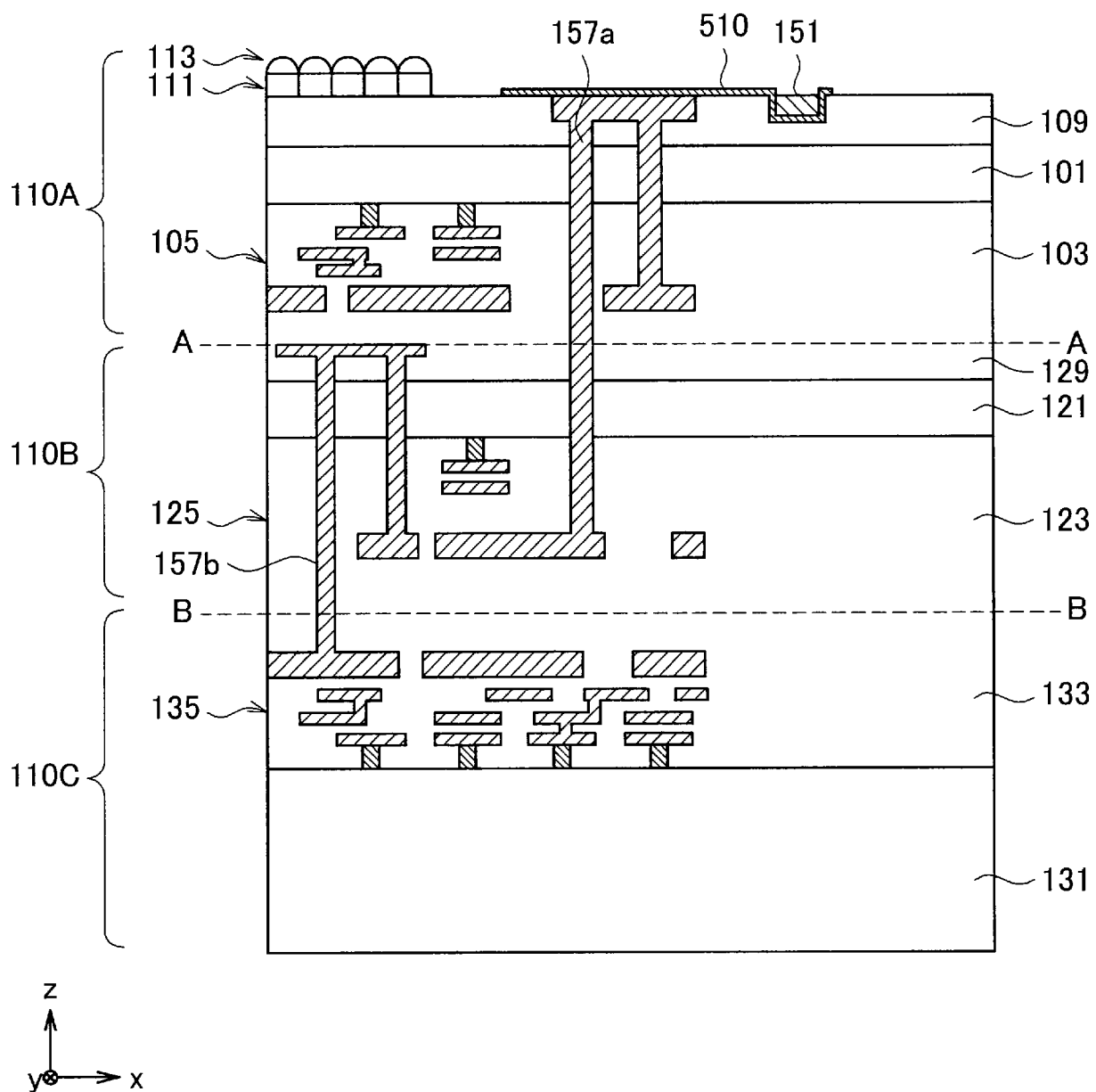
[図7L]



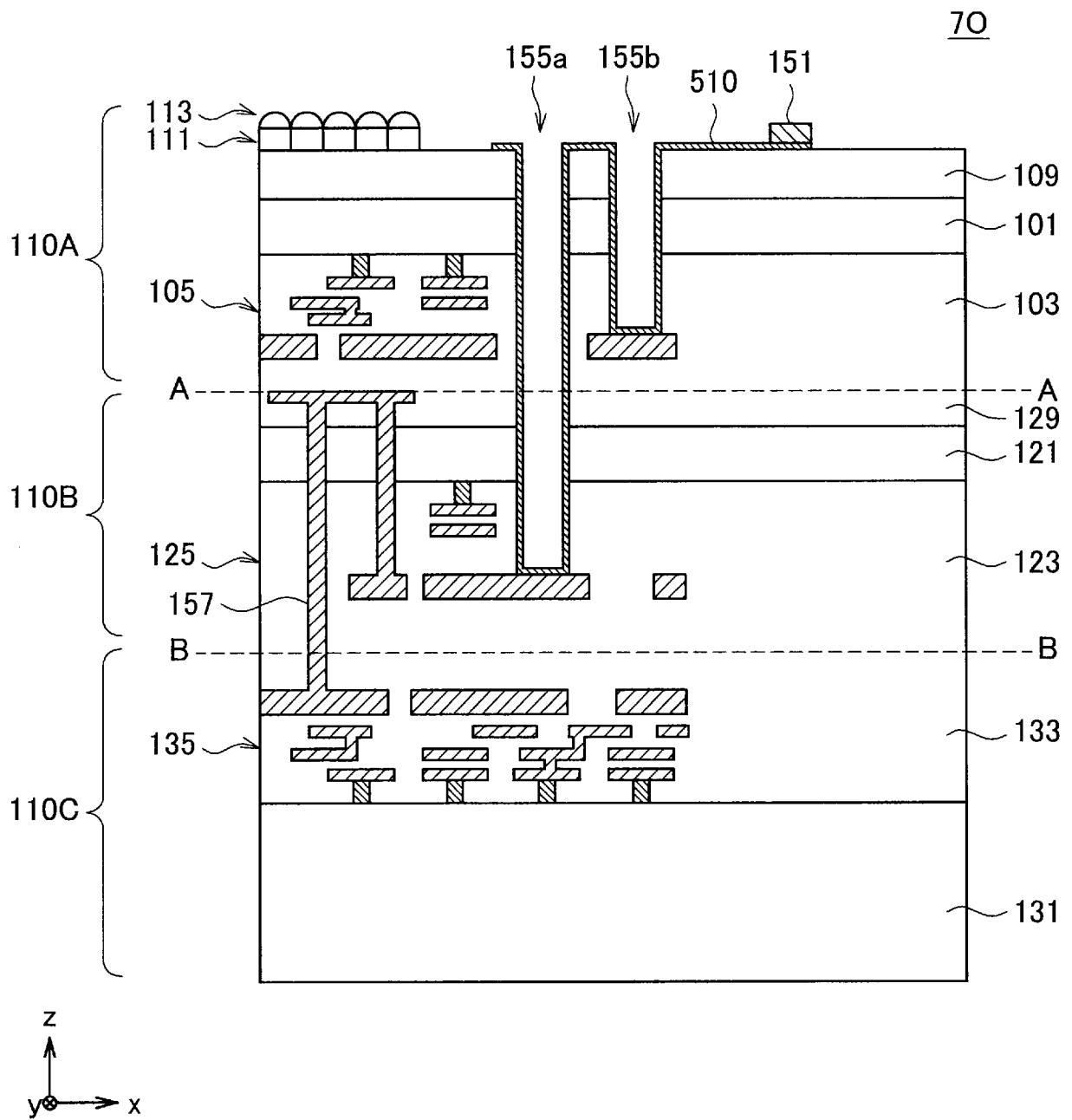
[図7M]



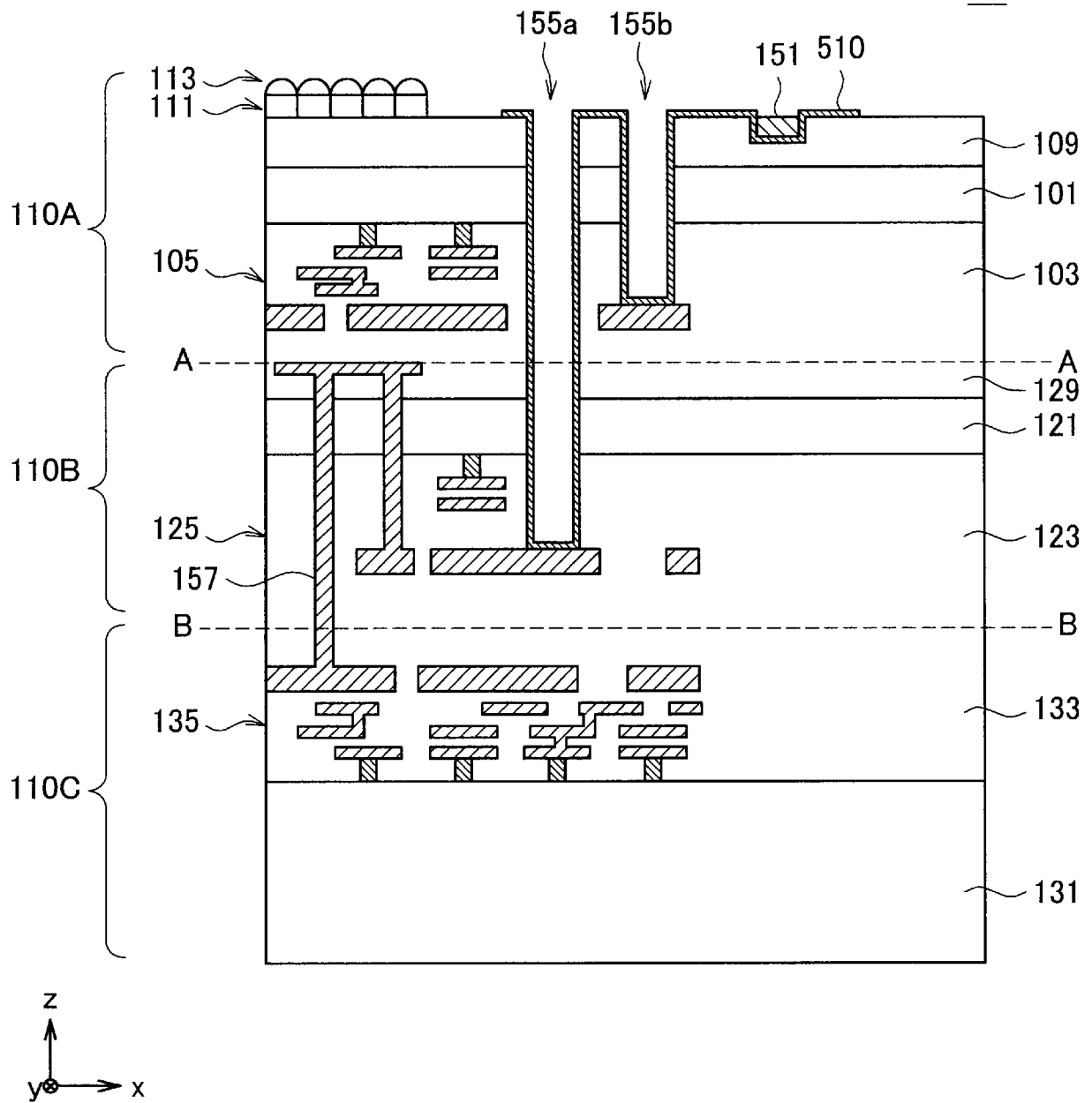
[図7N]

7N

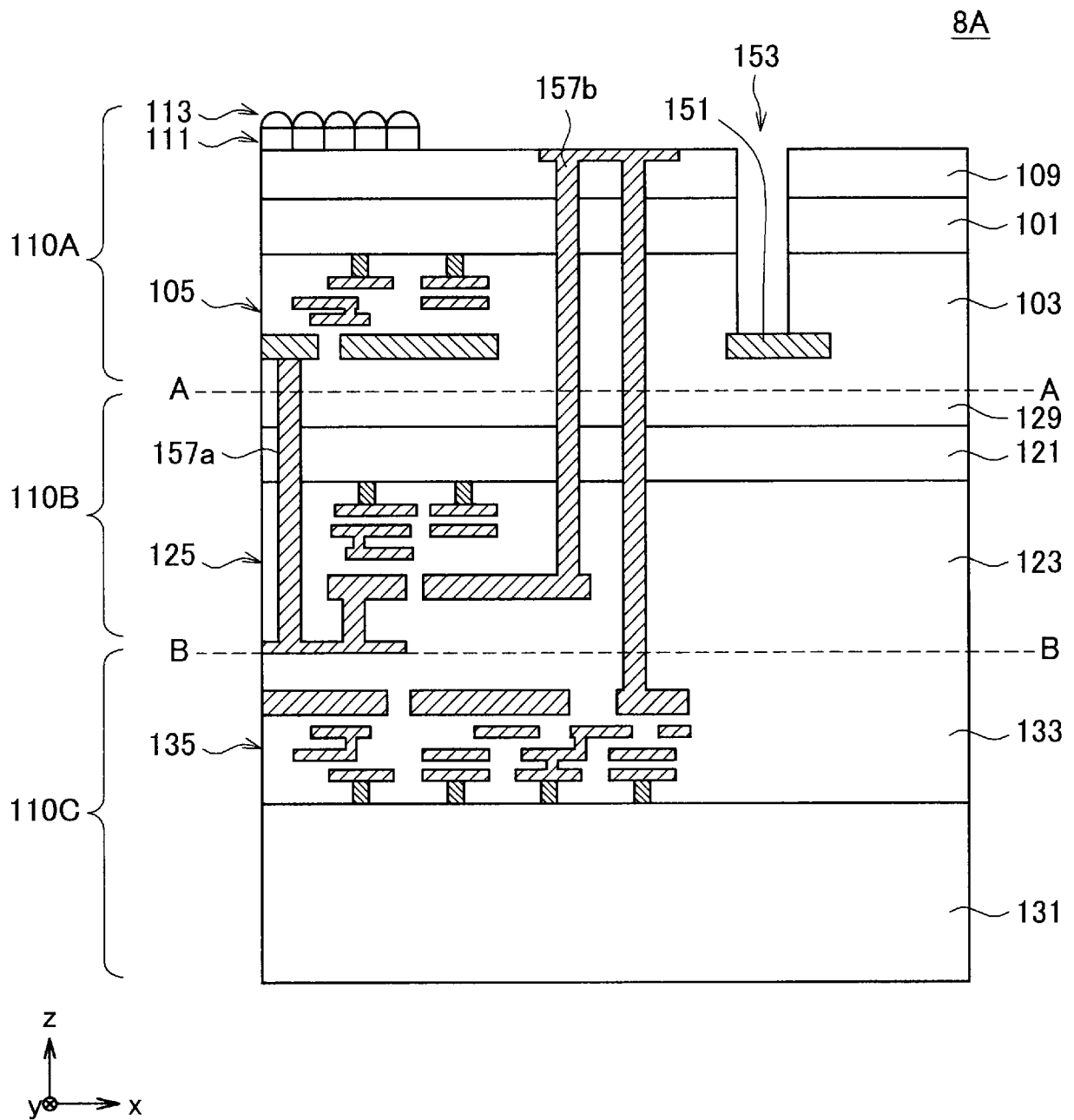
[図70]



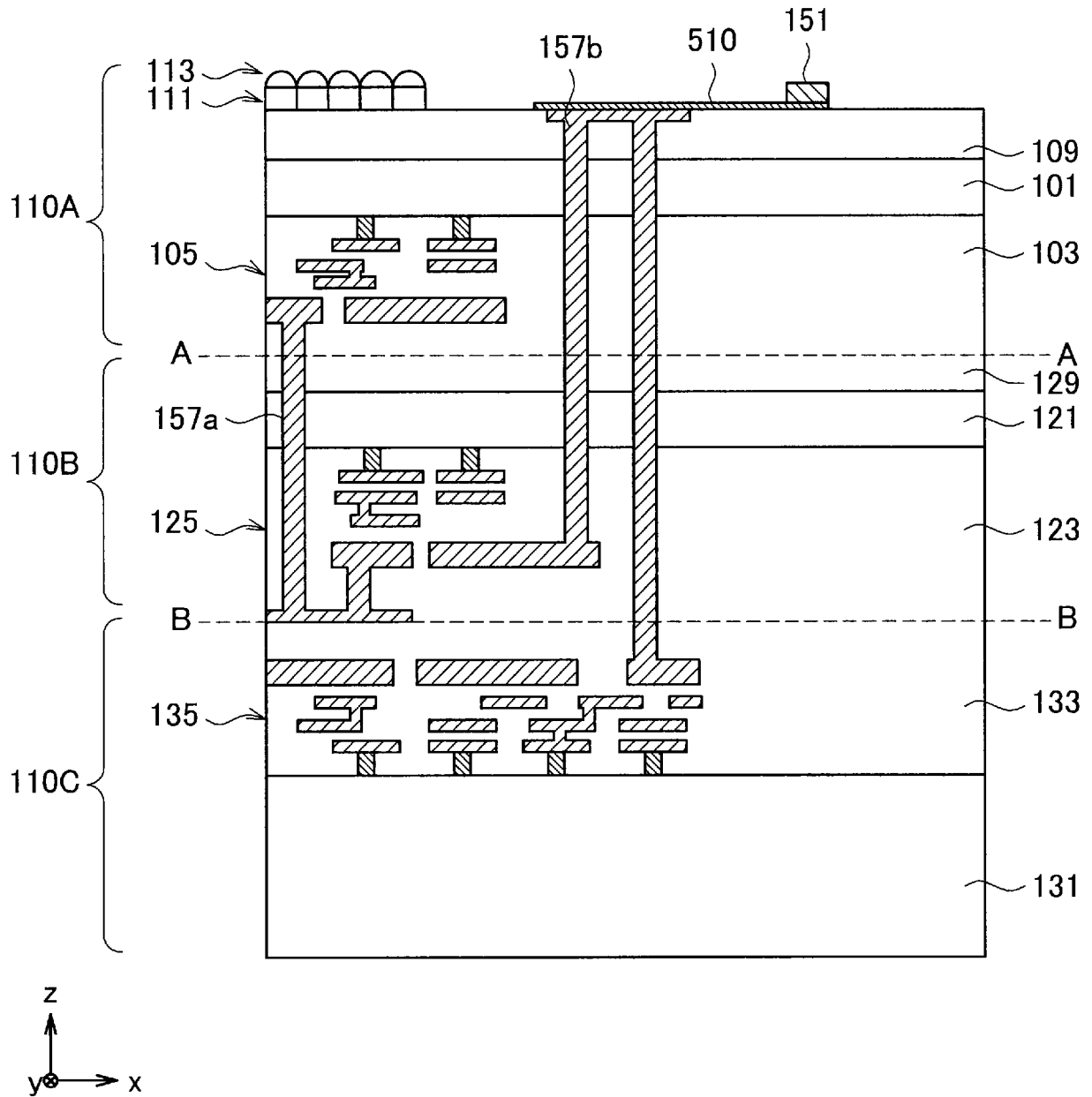
[図7P]

7P

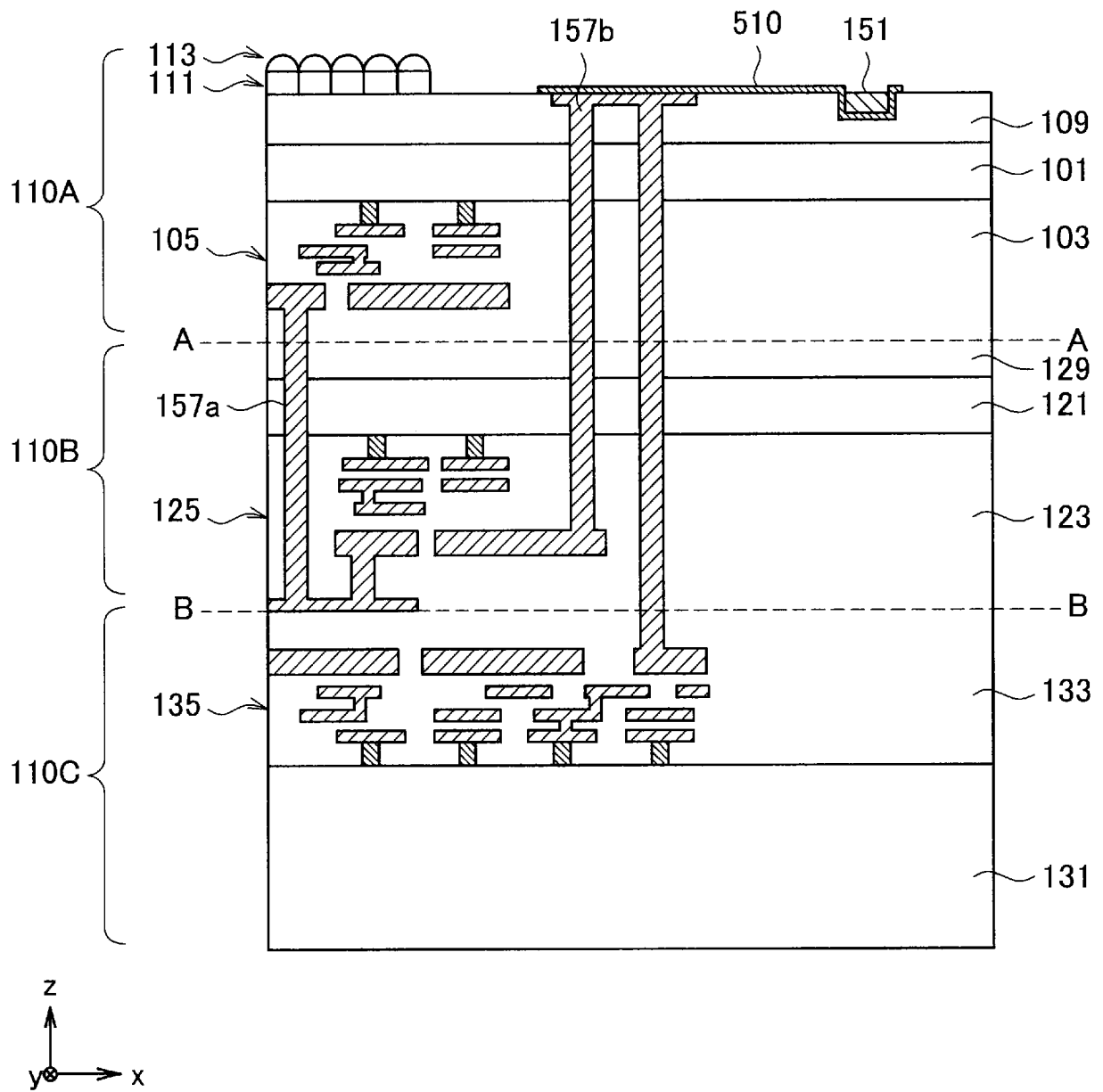
[図8A]



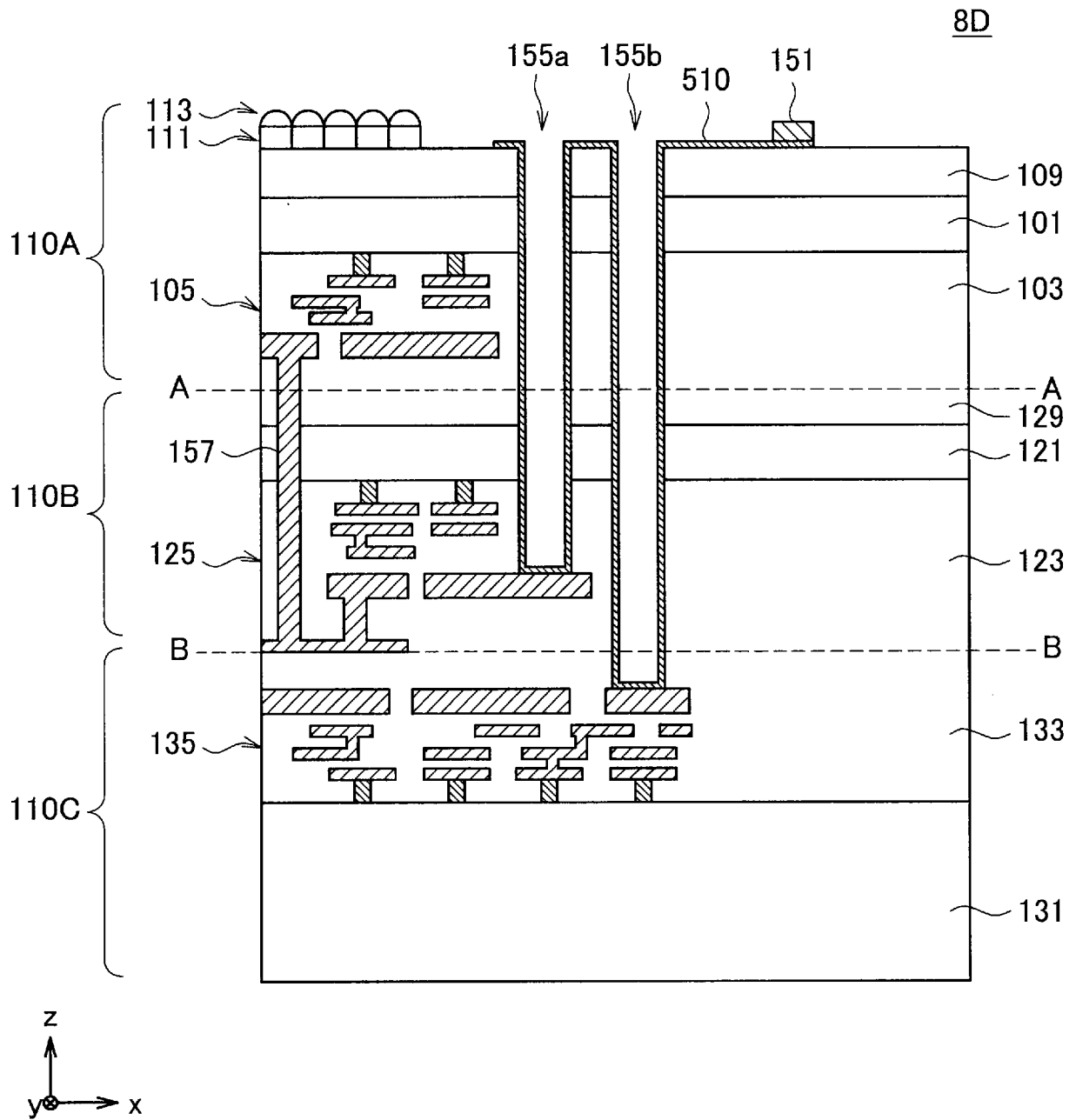
[図8B]

8B

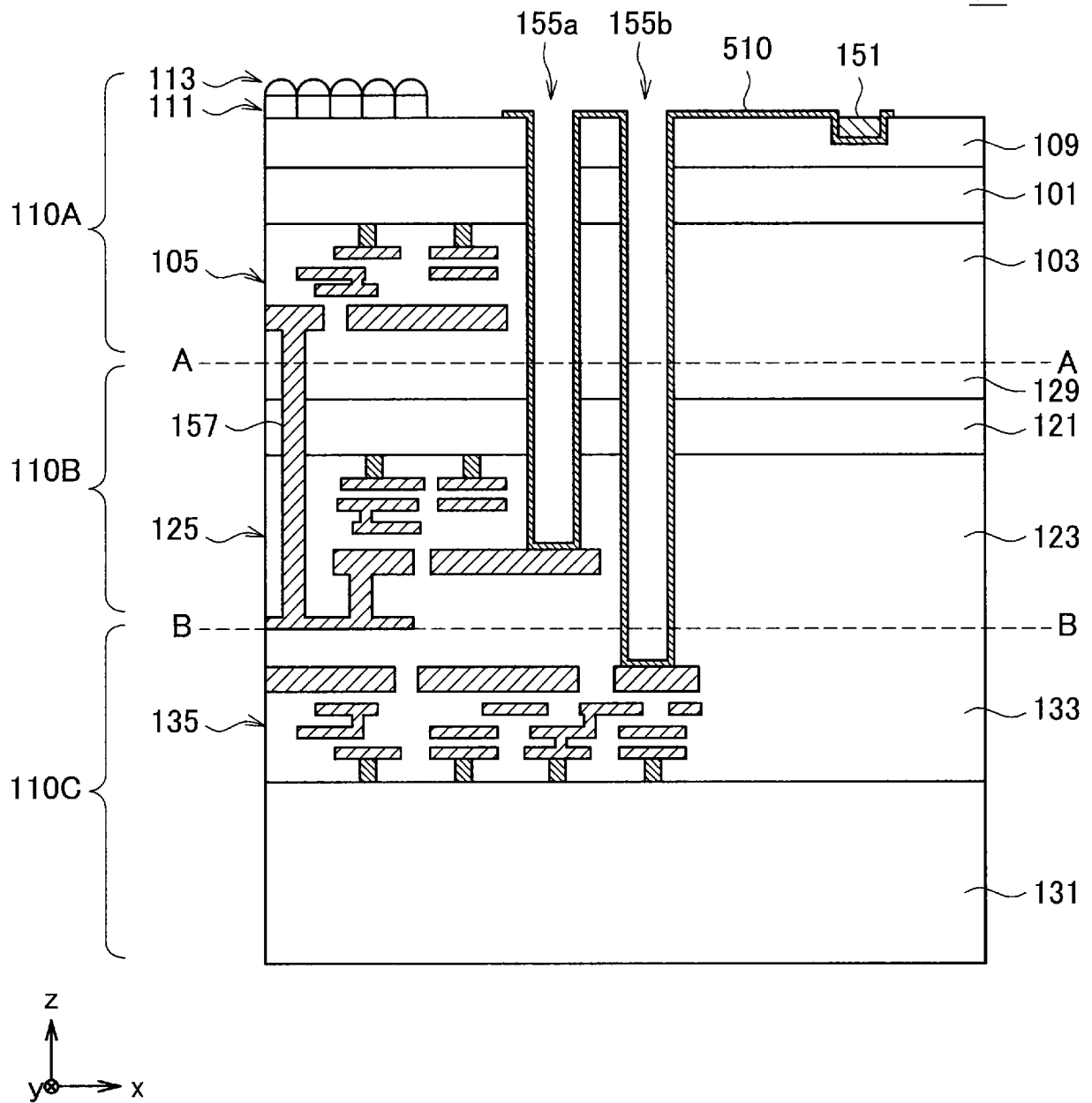
[図8C]

8C

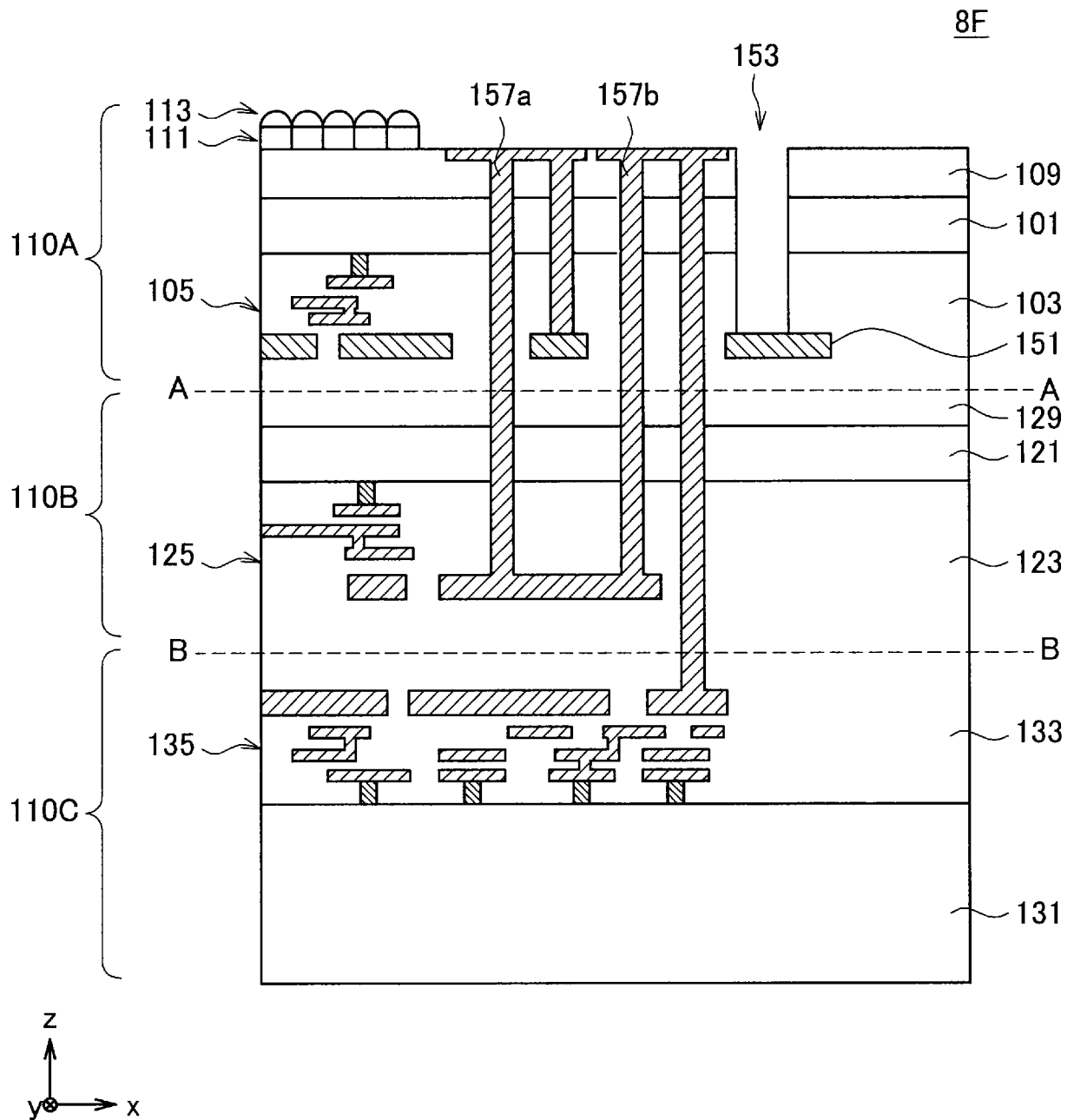
[図8D]



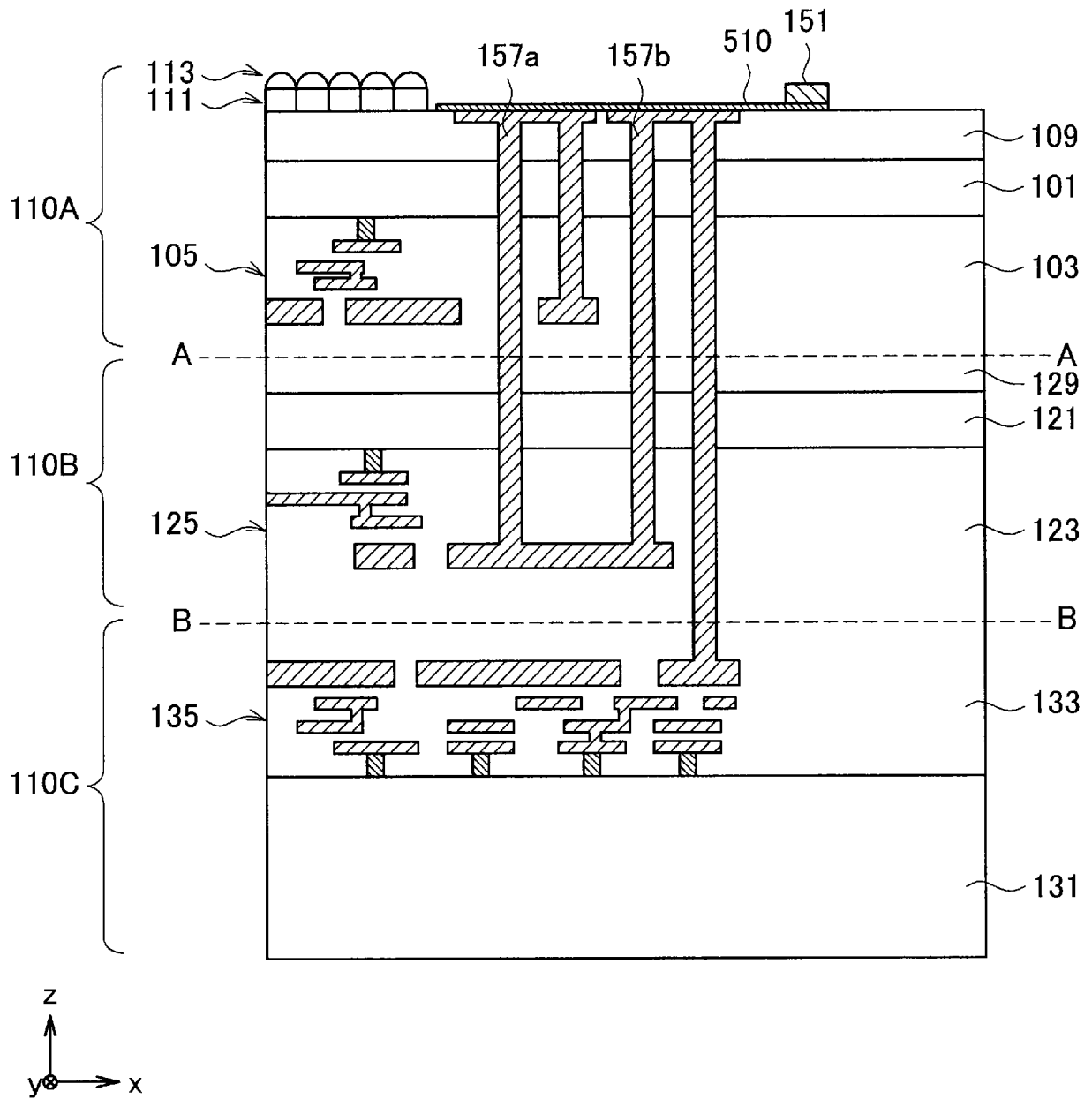
[図8E]

8E

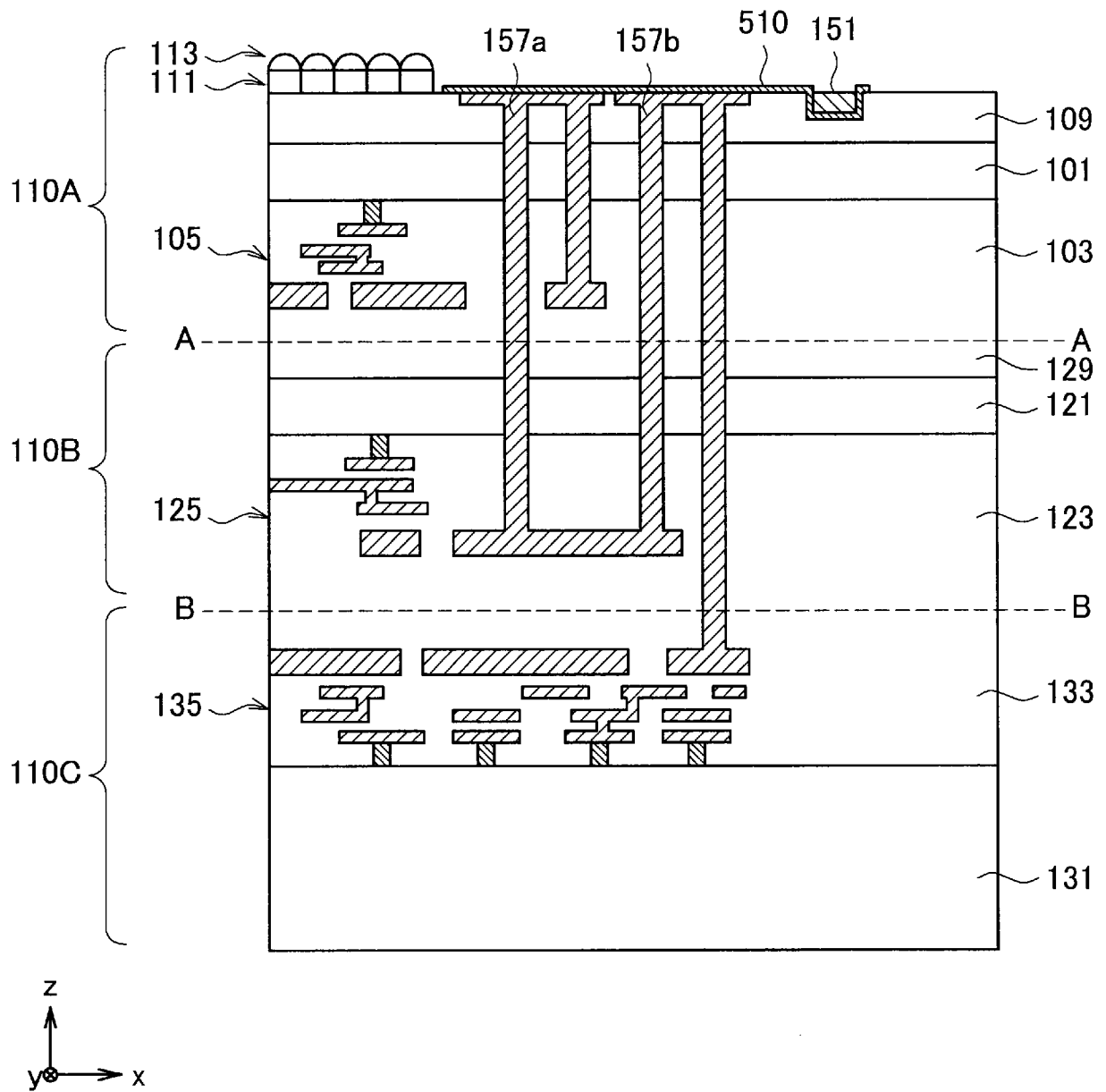
[図8F]



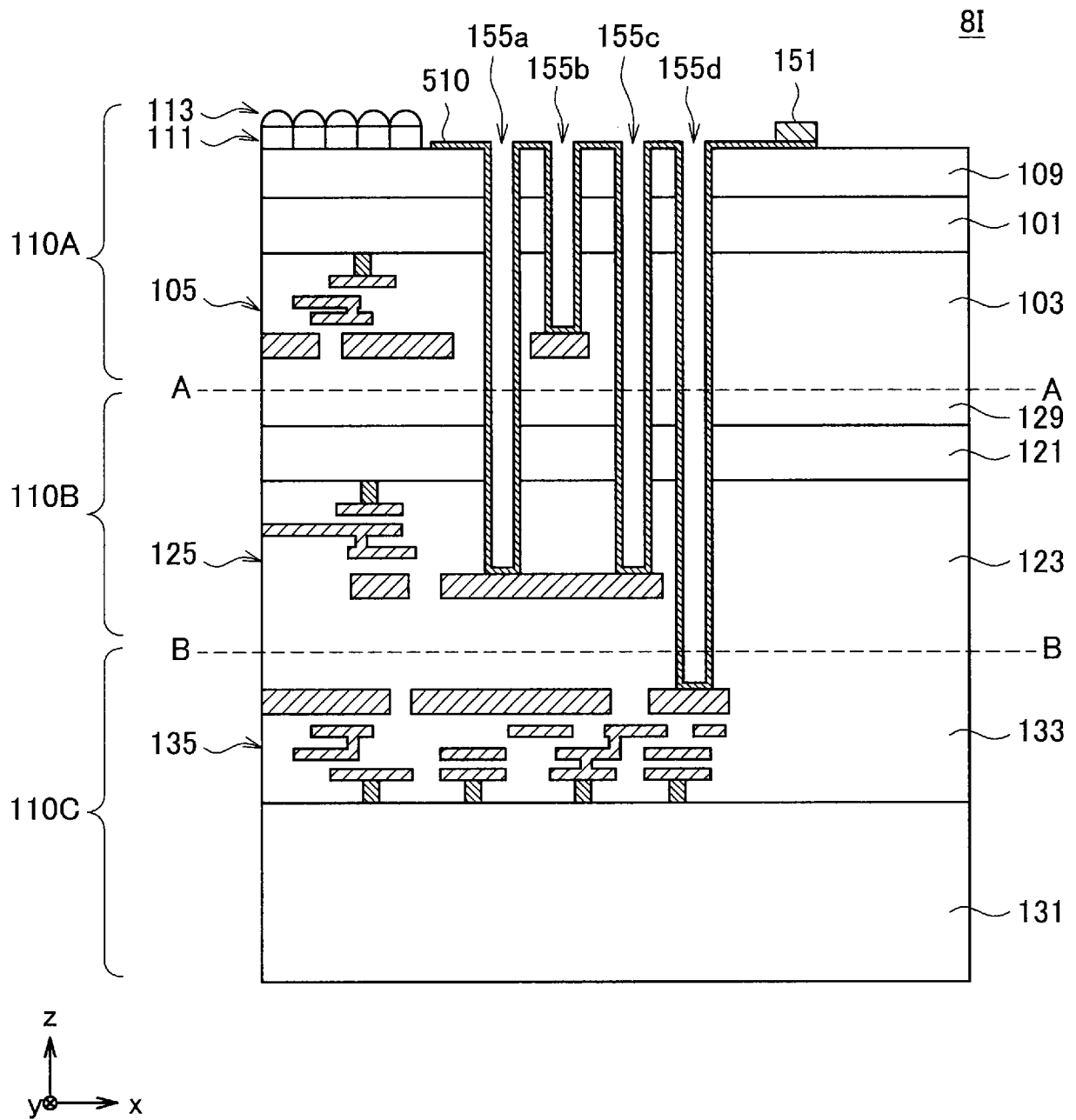
[図8G]

8G

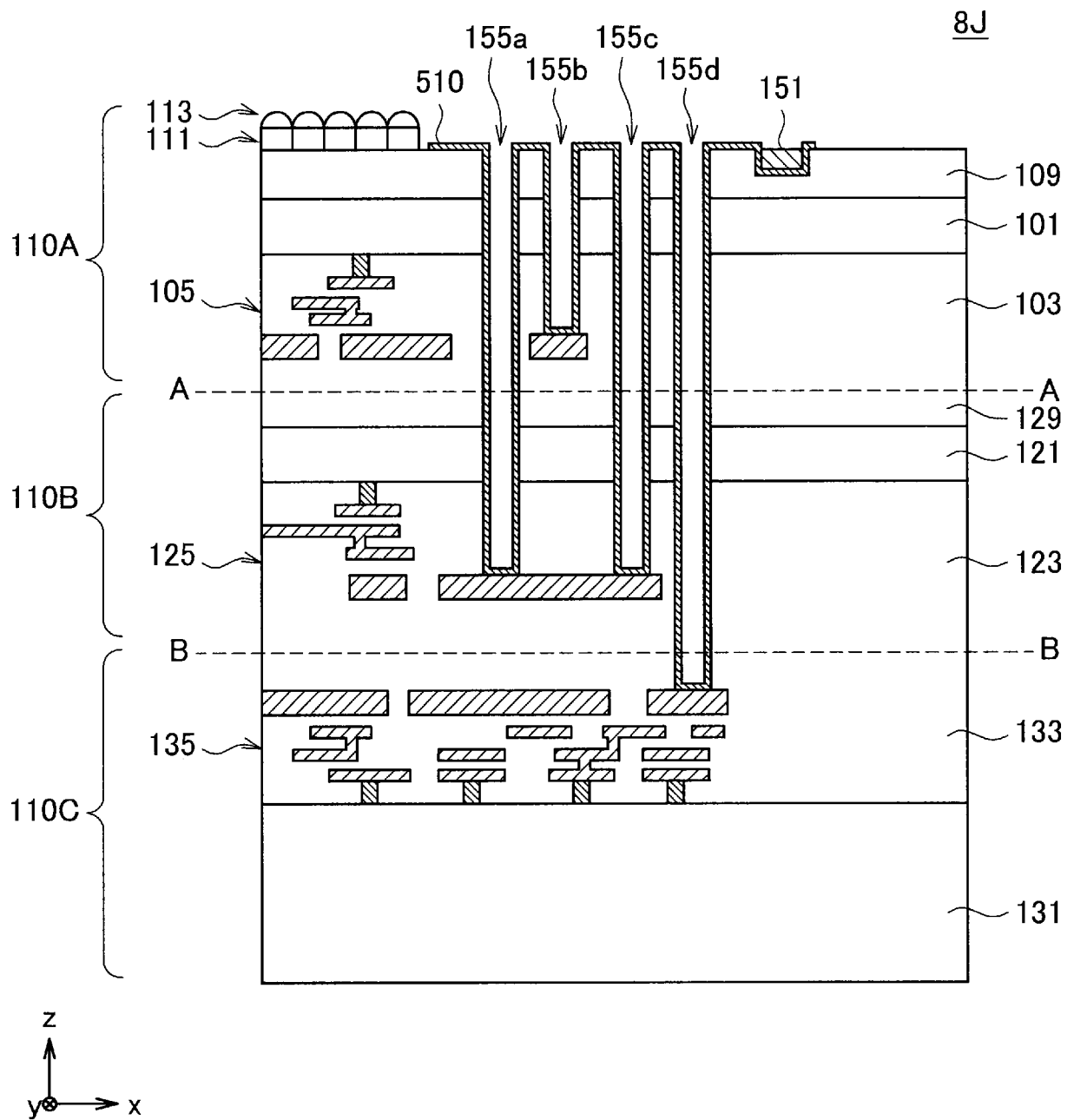
[図8H]

8H

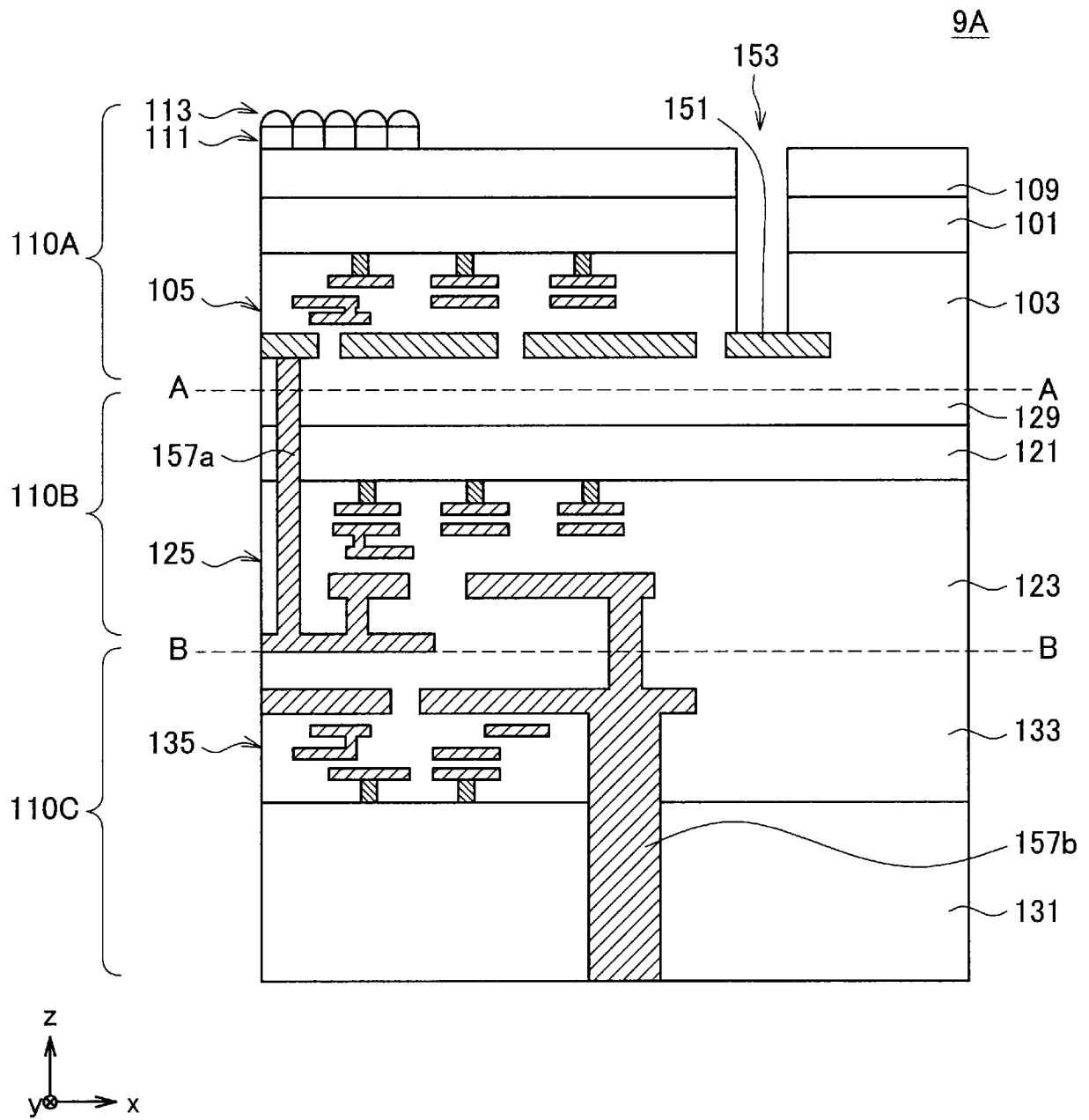
[図8I]



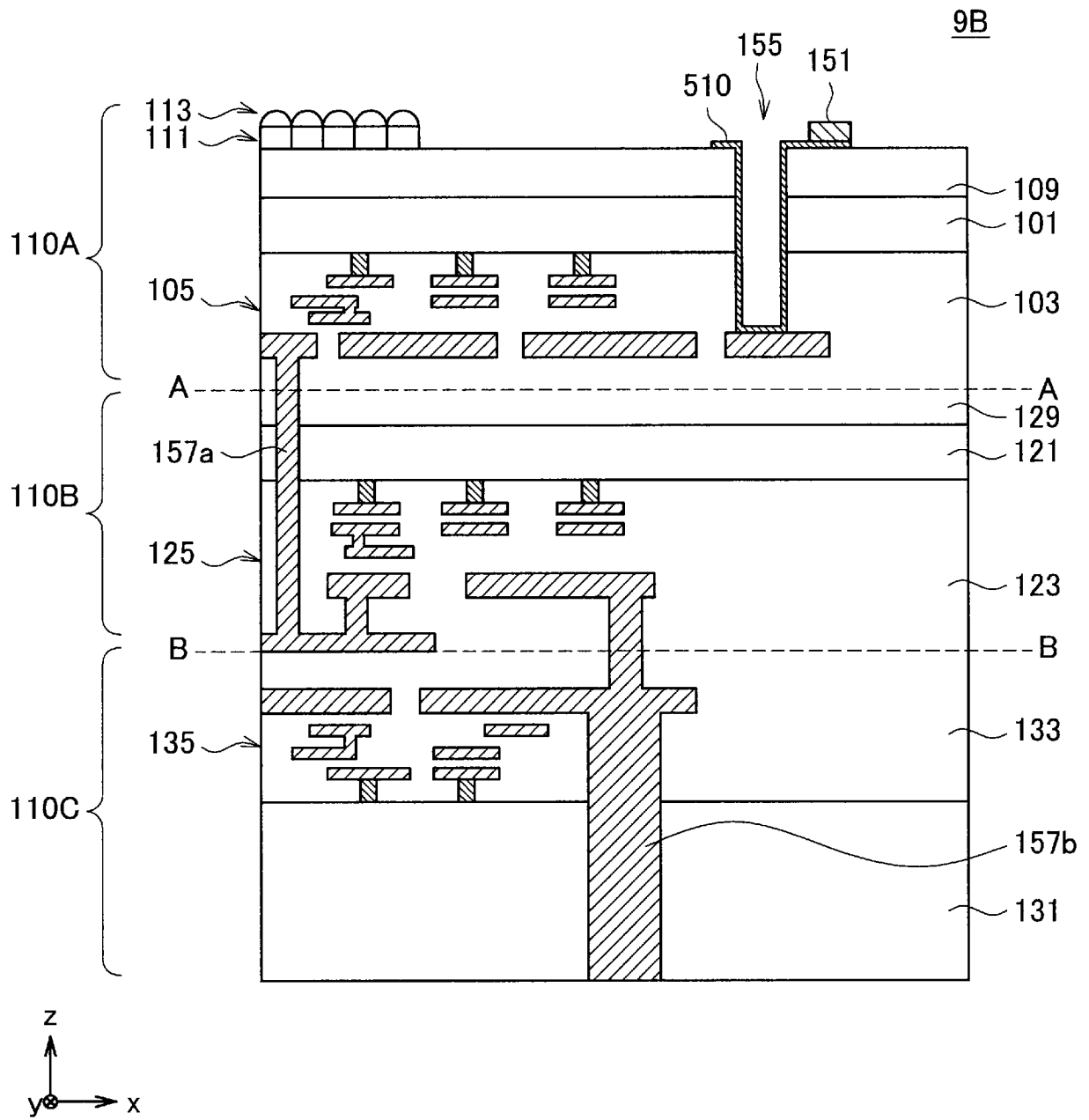
[図8J]



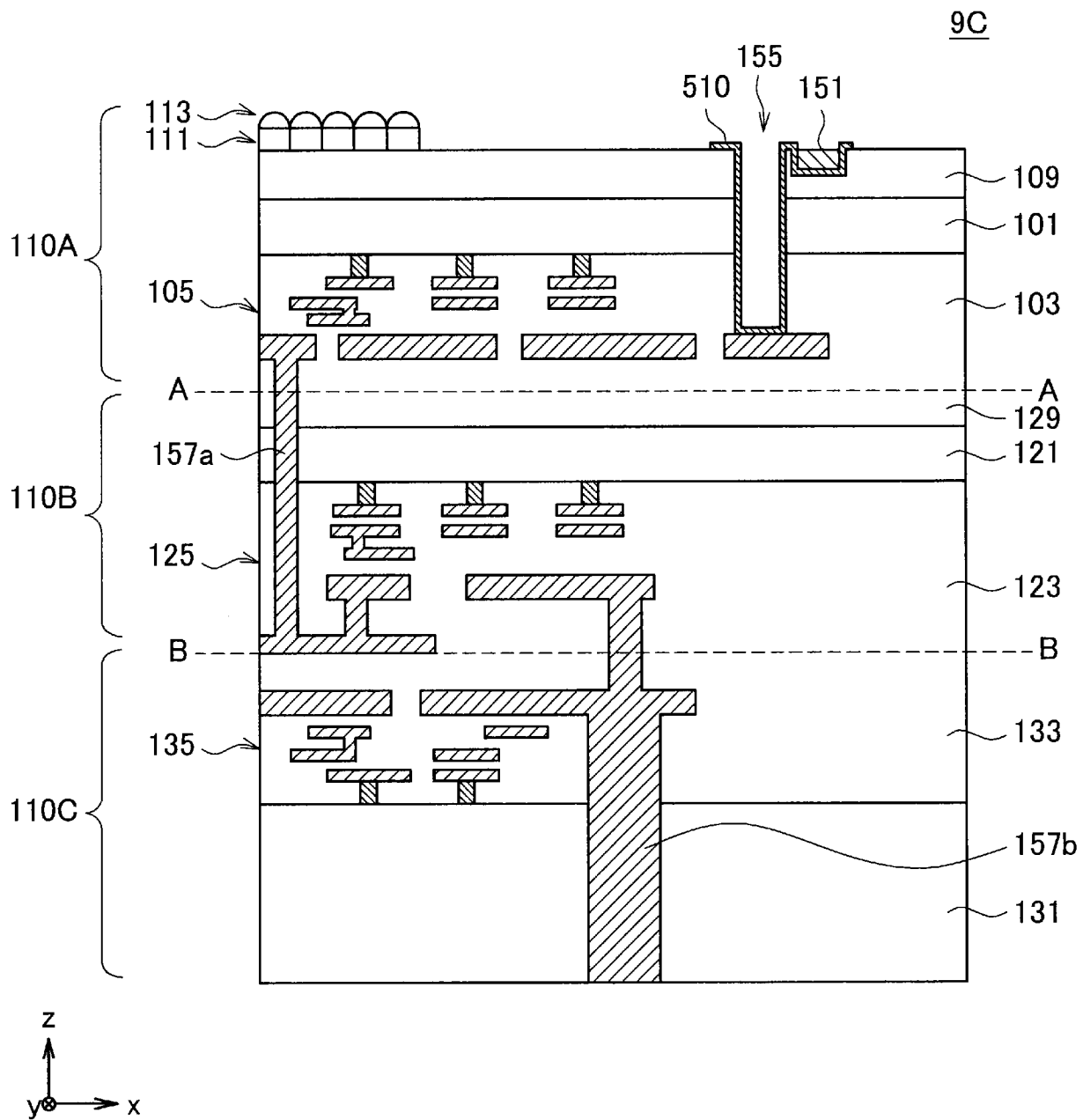
[図9A]



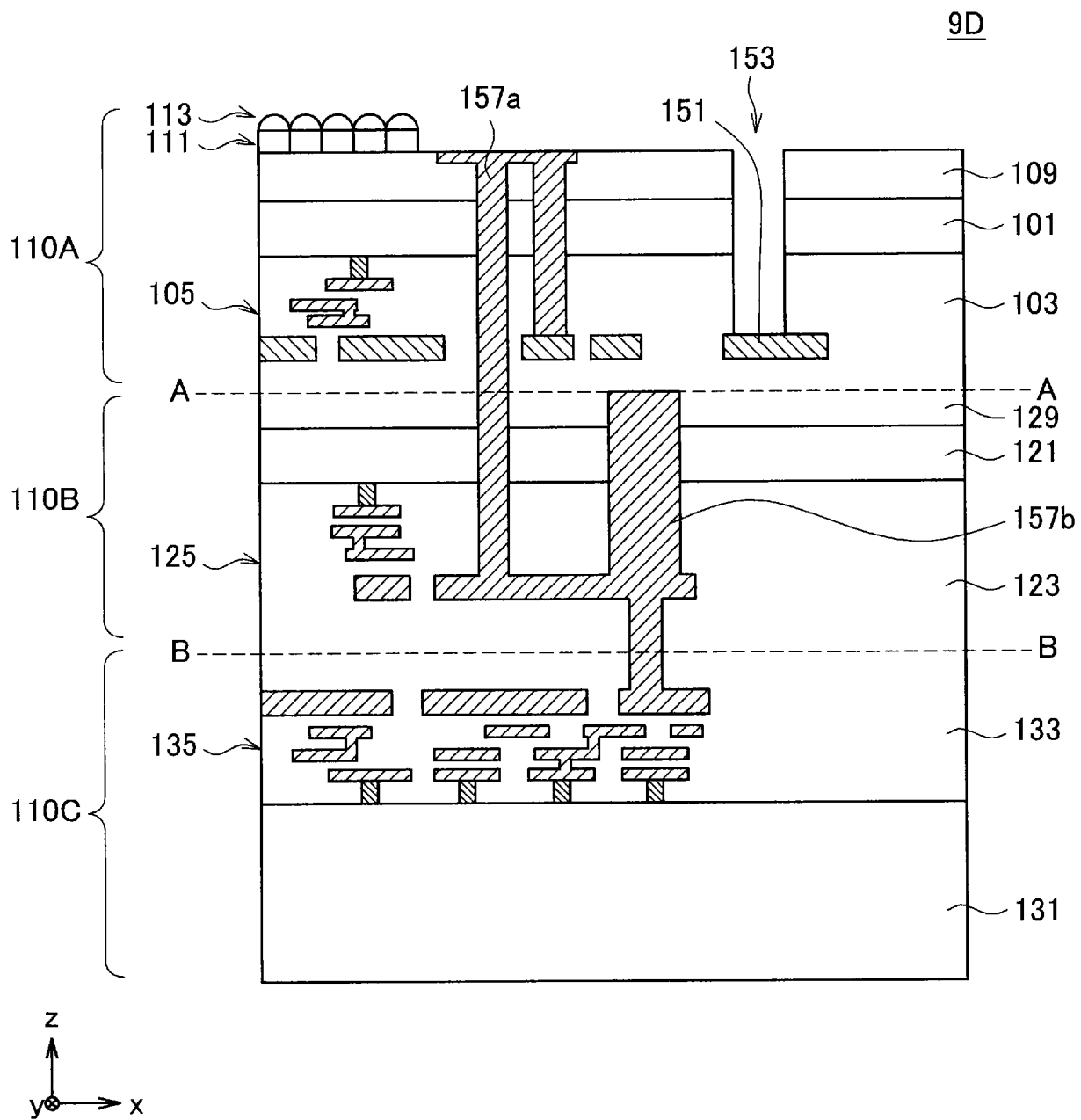
[図9B]



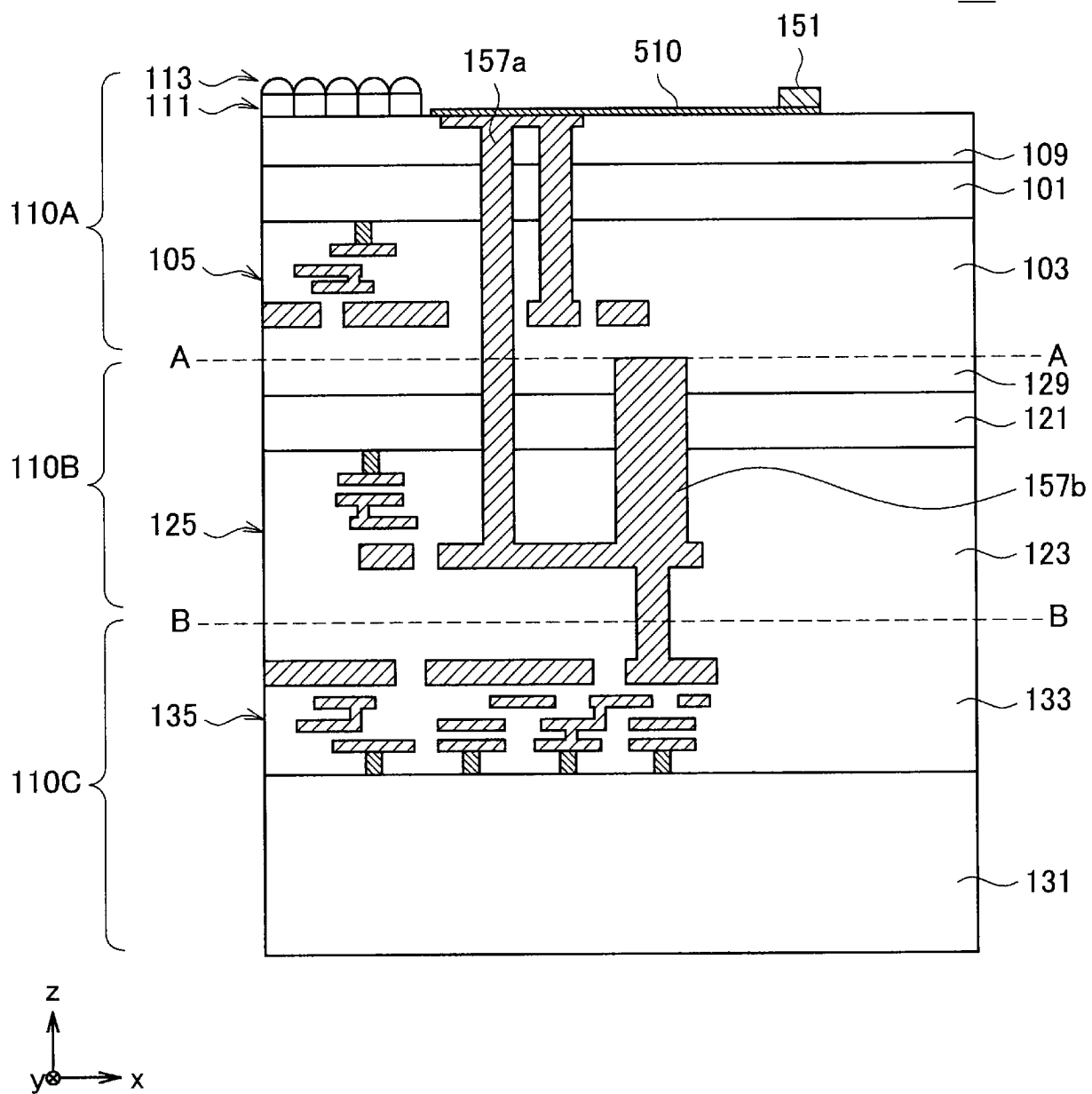
[図9C]



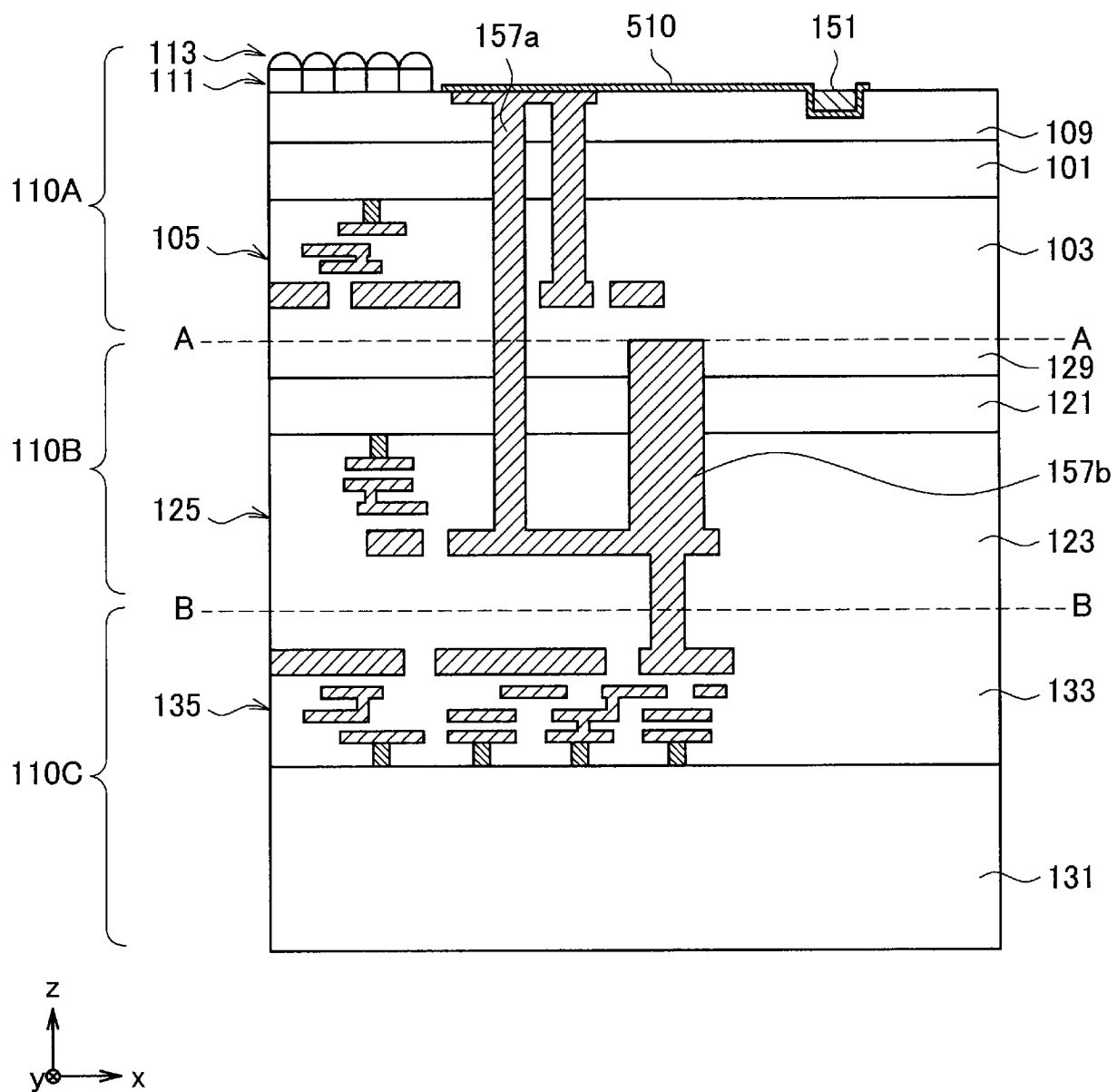
[図9D]



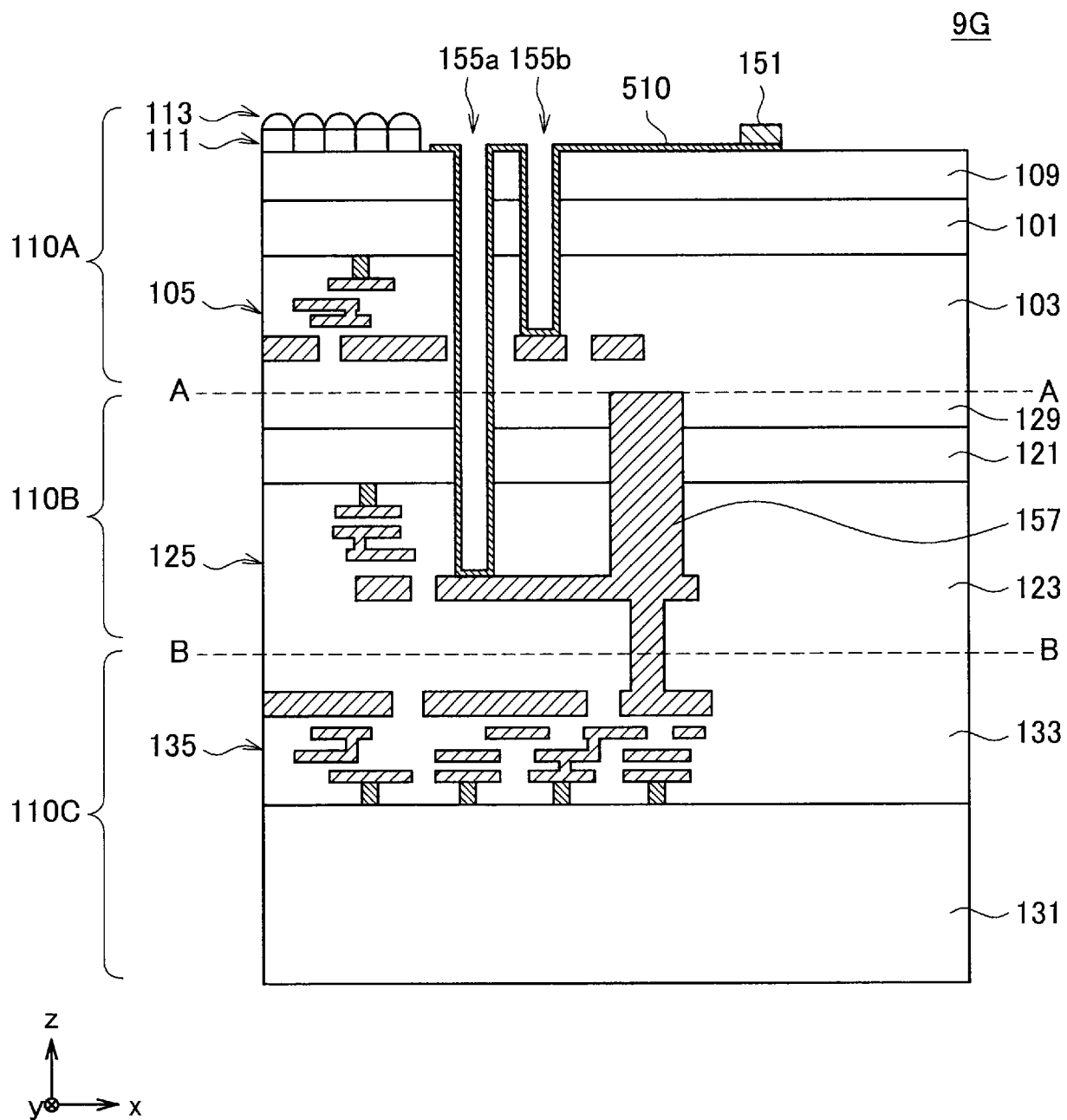
[図9E]

9E

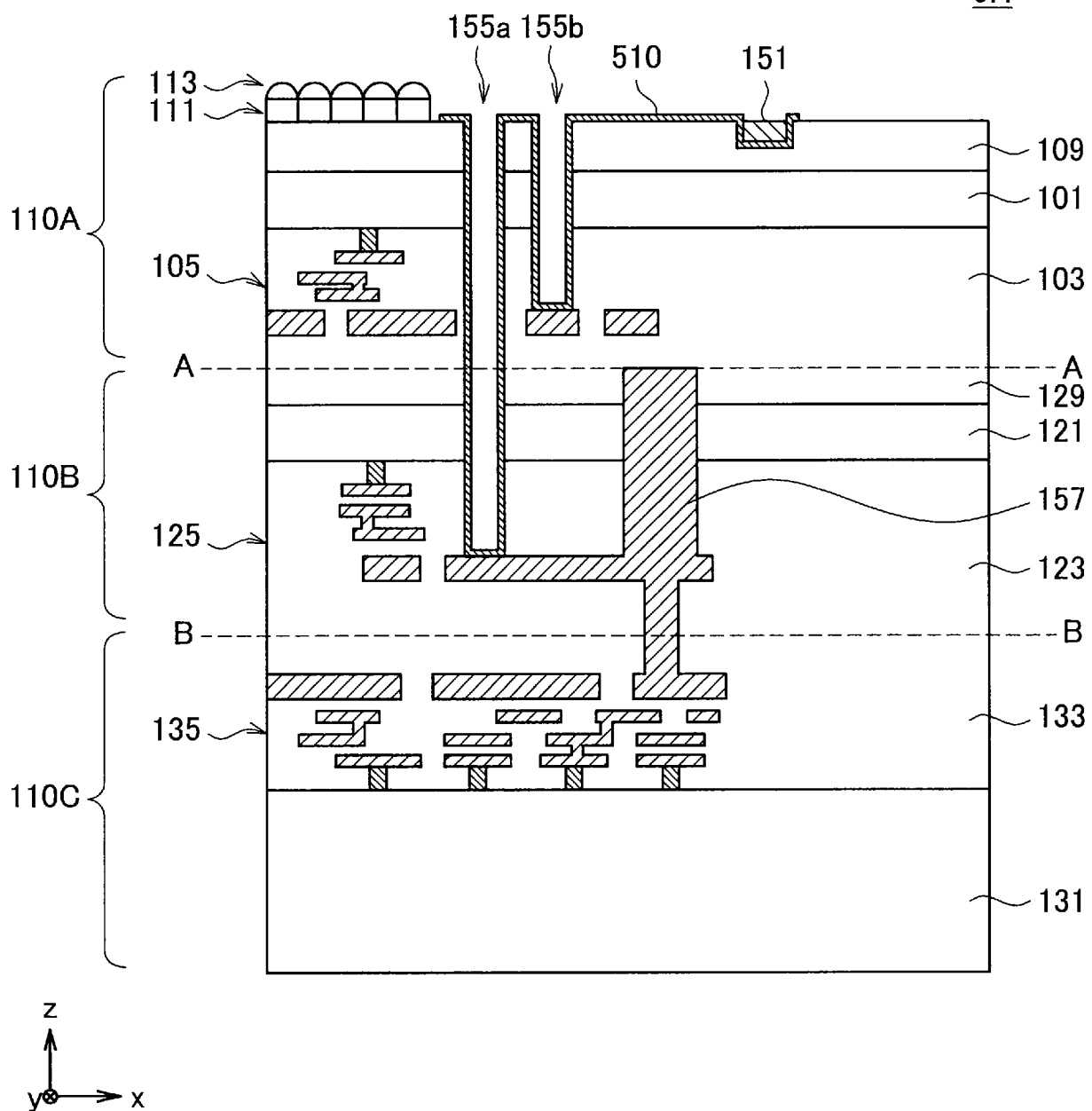
[図9F]

9F

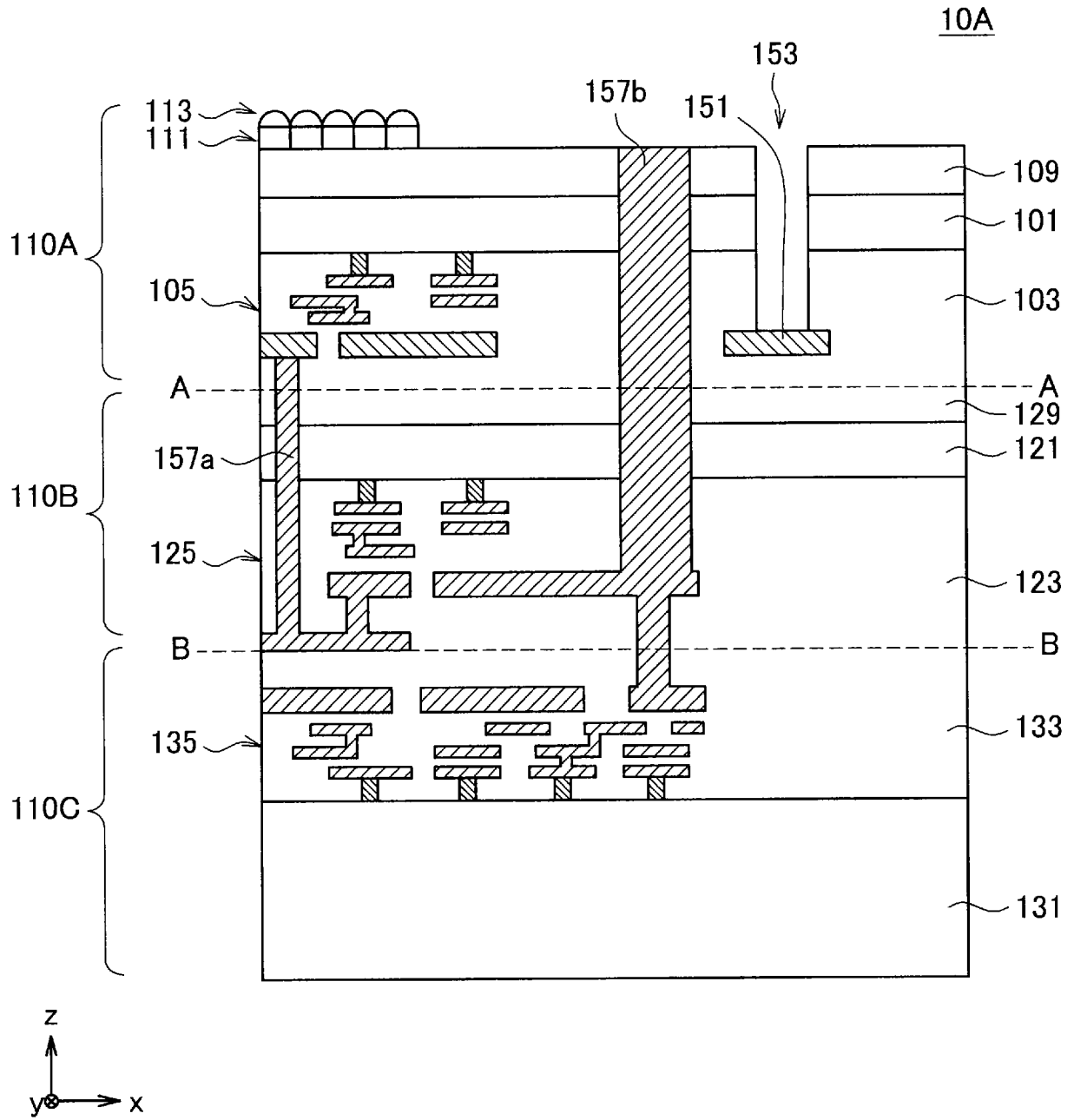
[図9G]



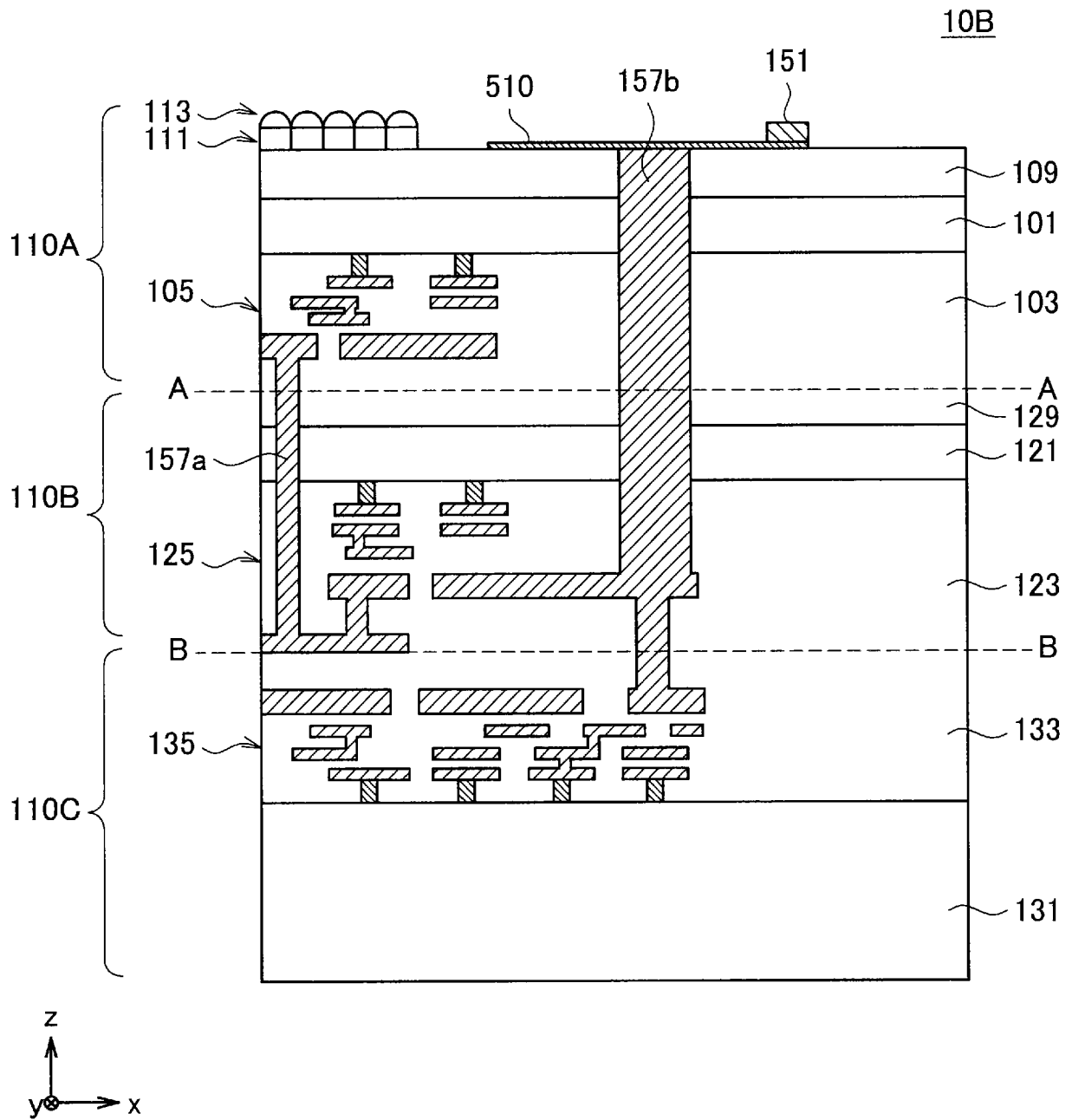
[図9H]

9H

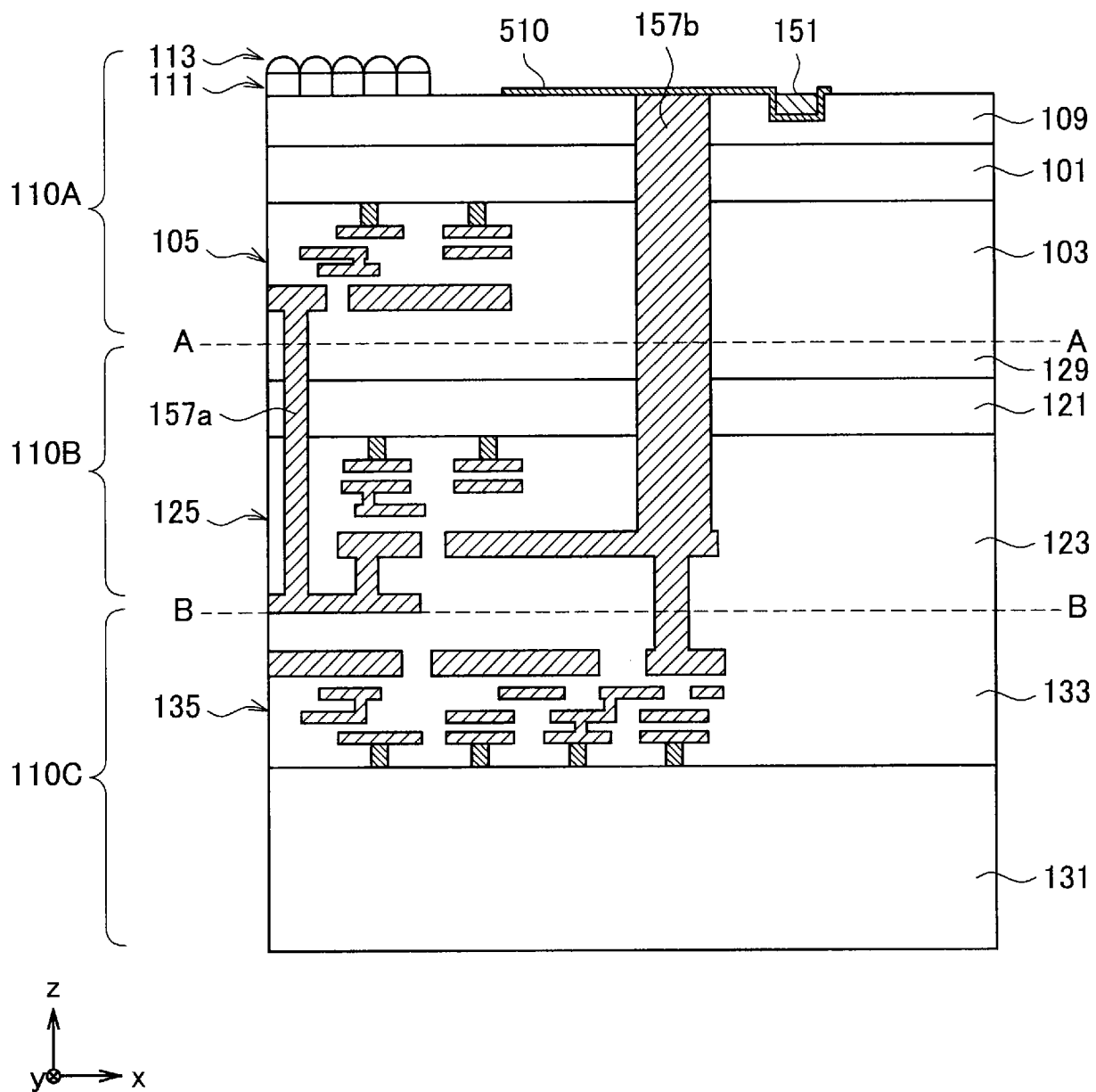
[図10A]



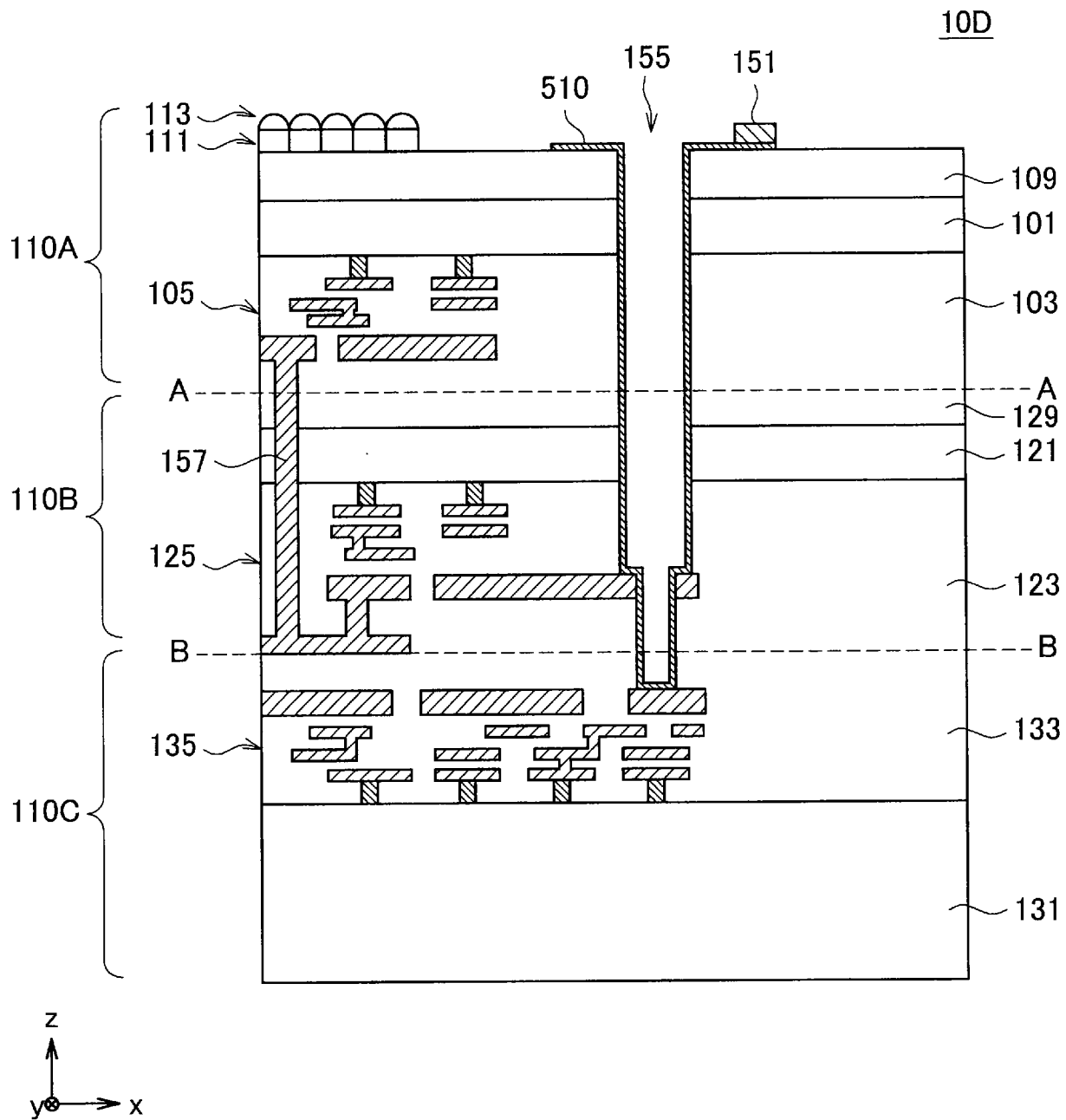
[図10B]



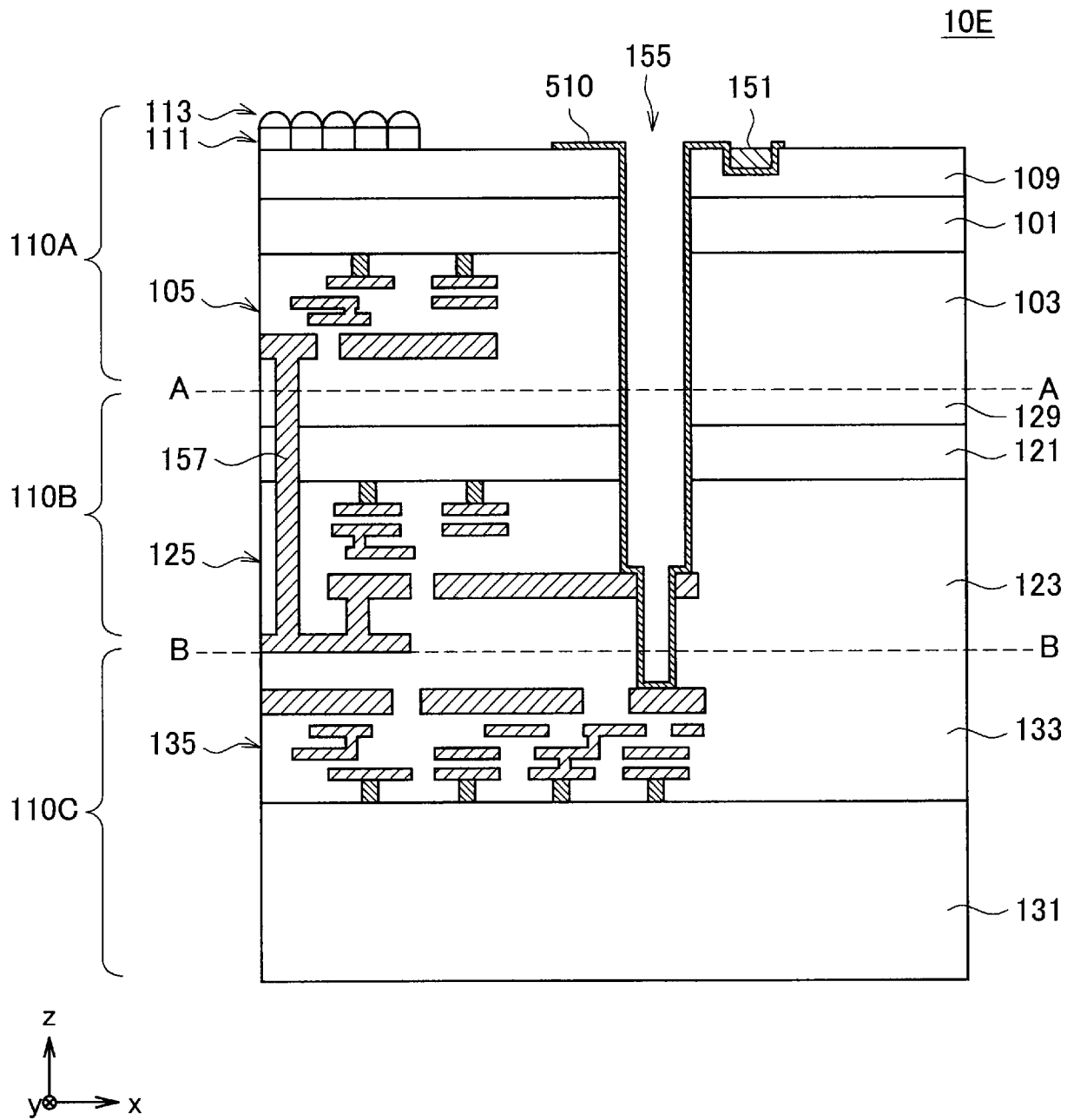
10C



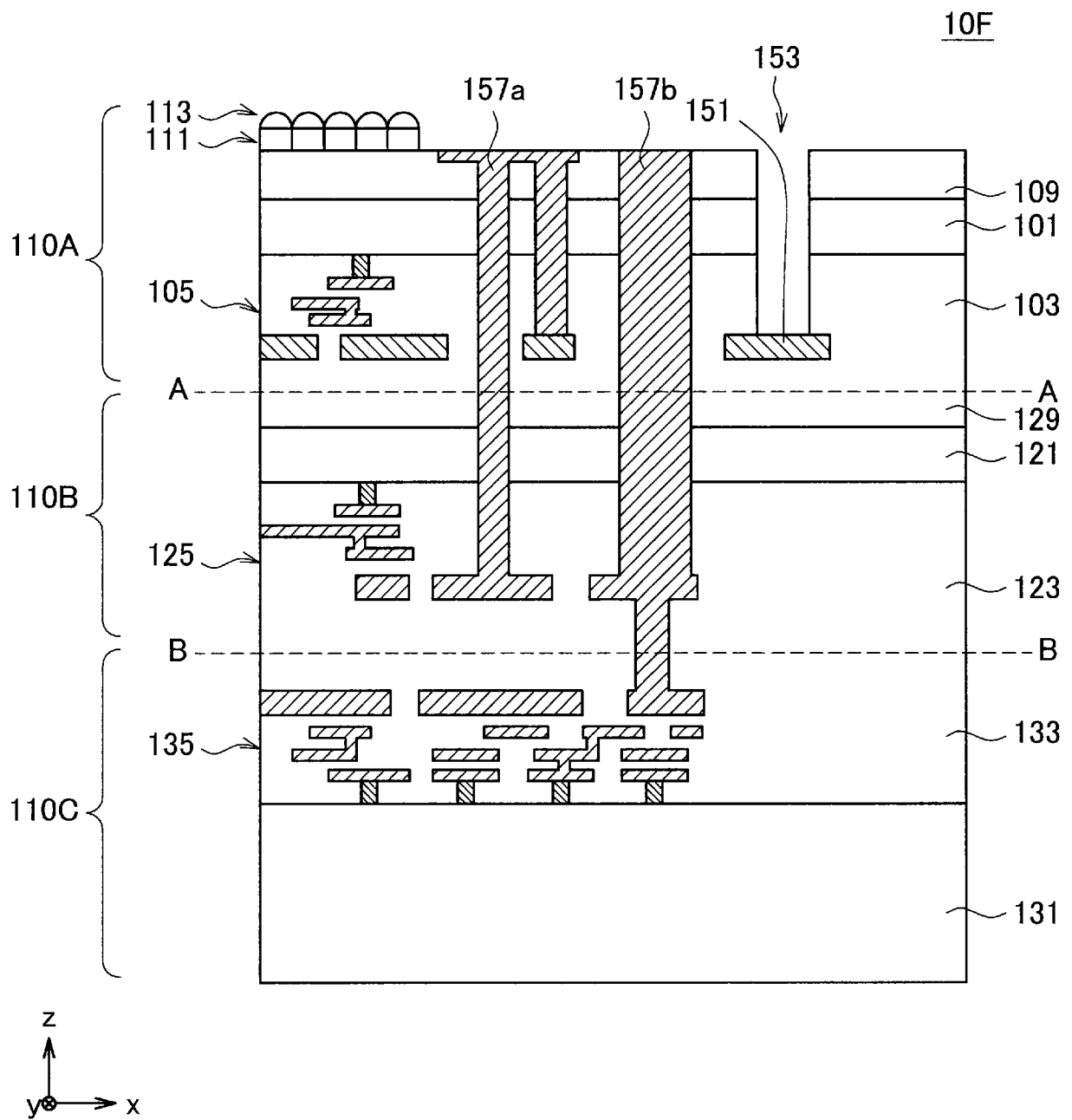
[図10D]



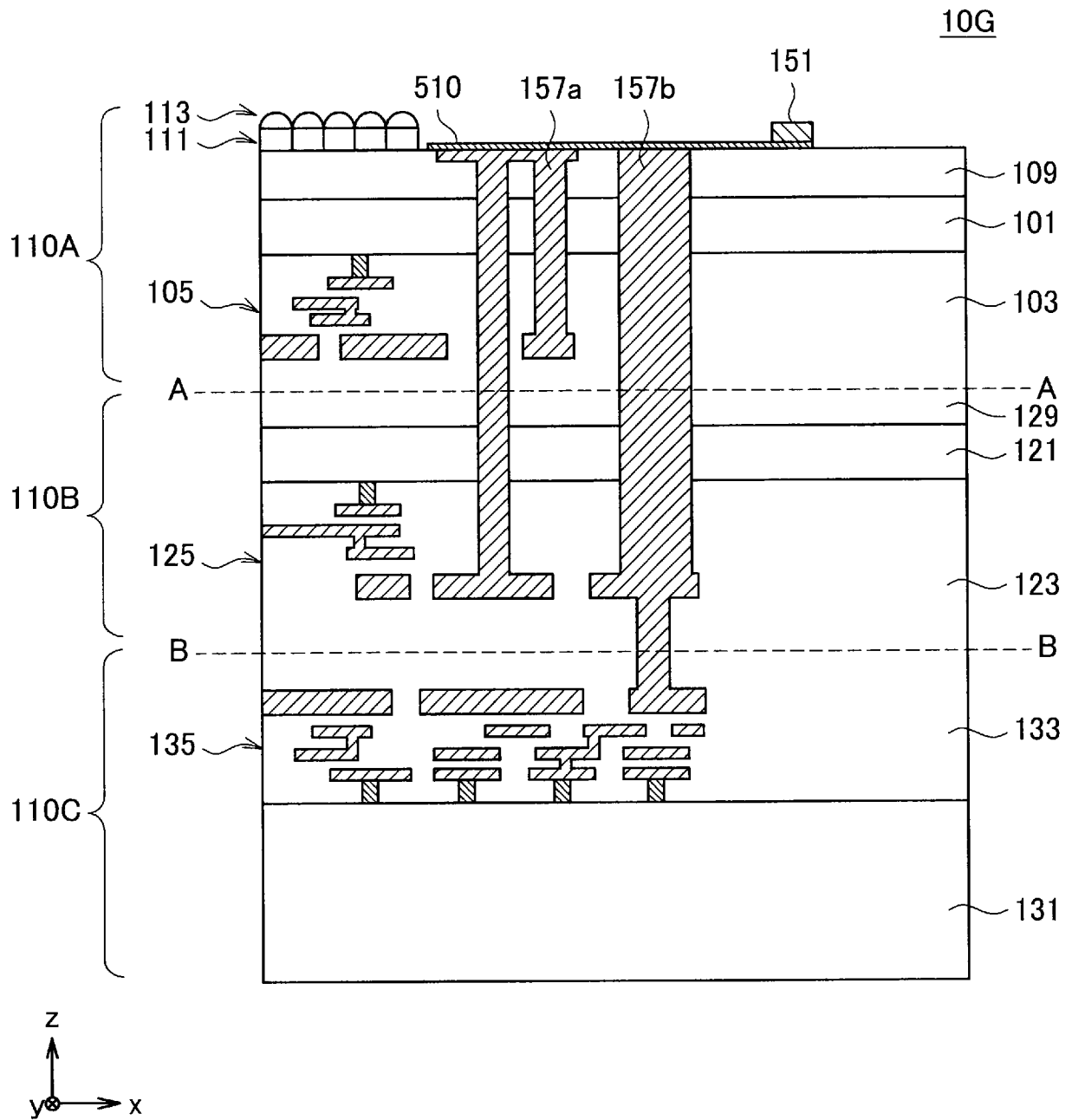
[図10E]



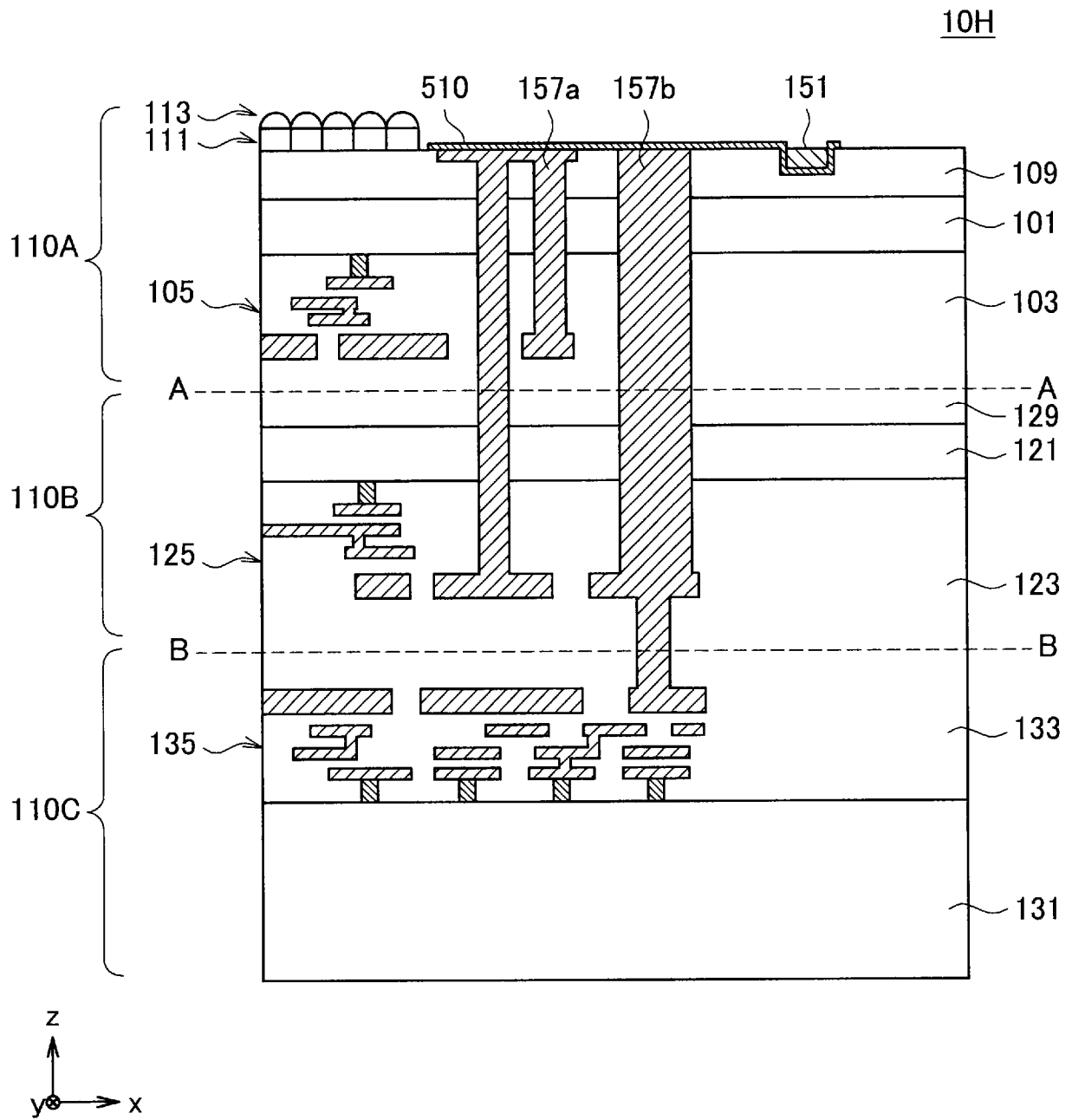
[図10F]



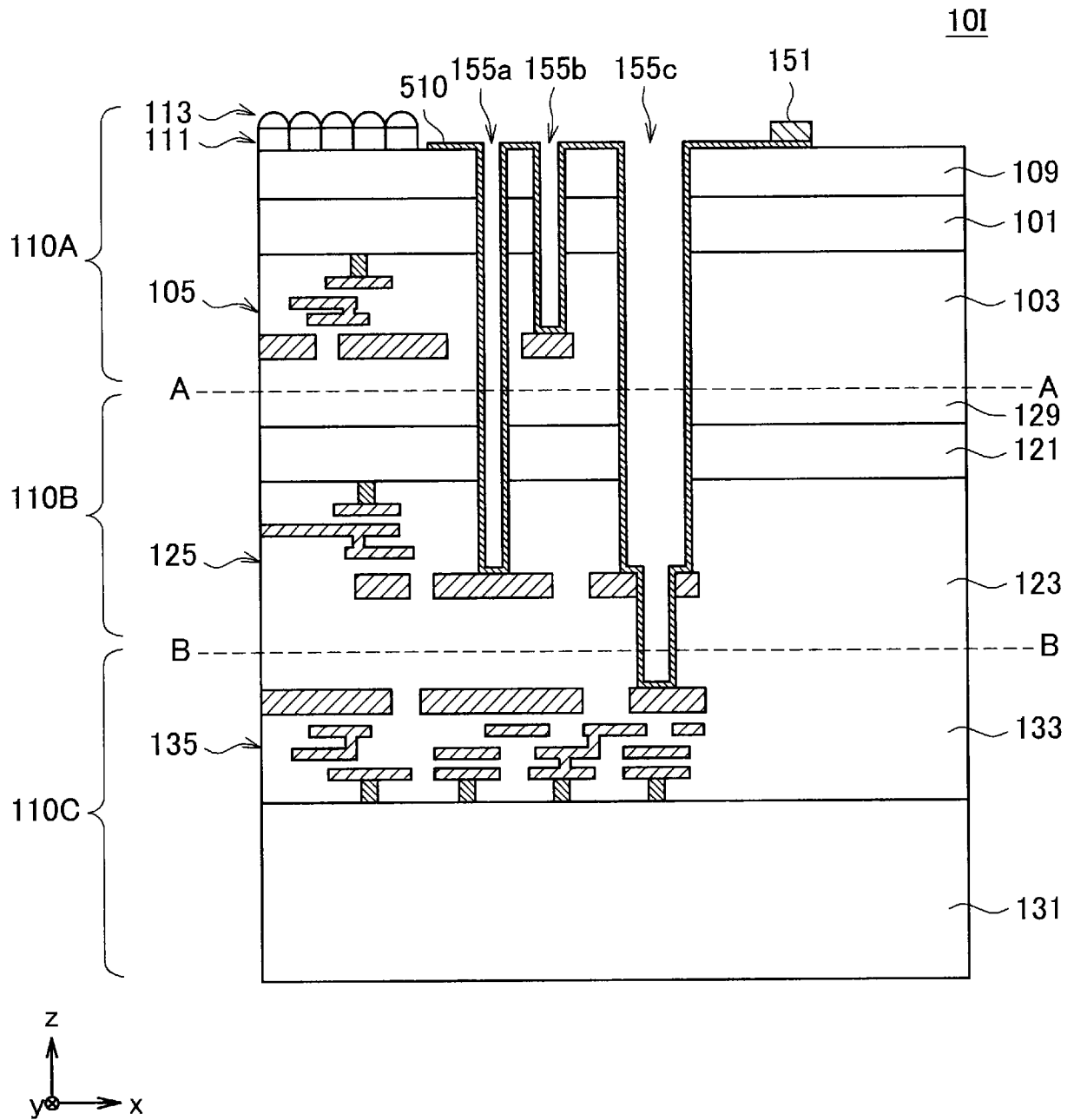
[図10G]



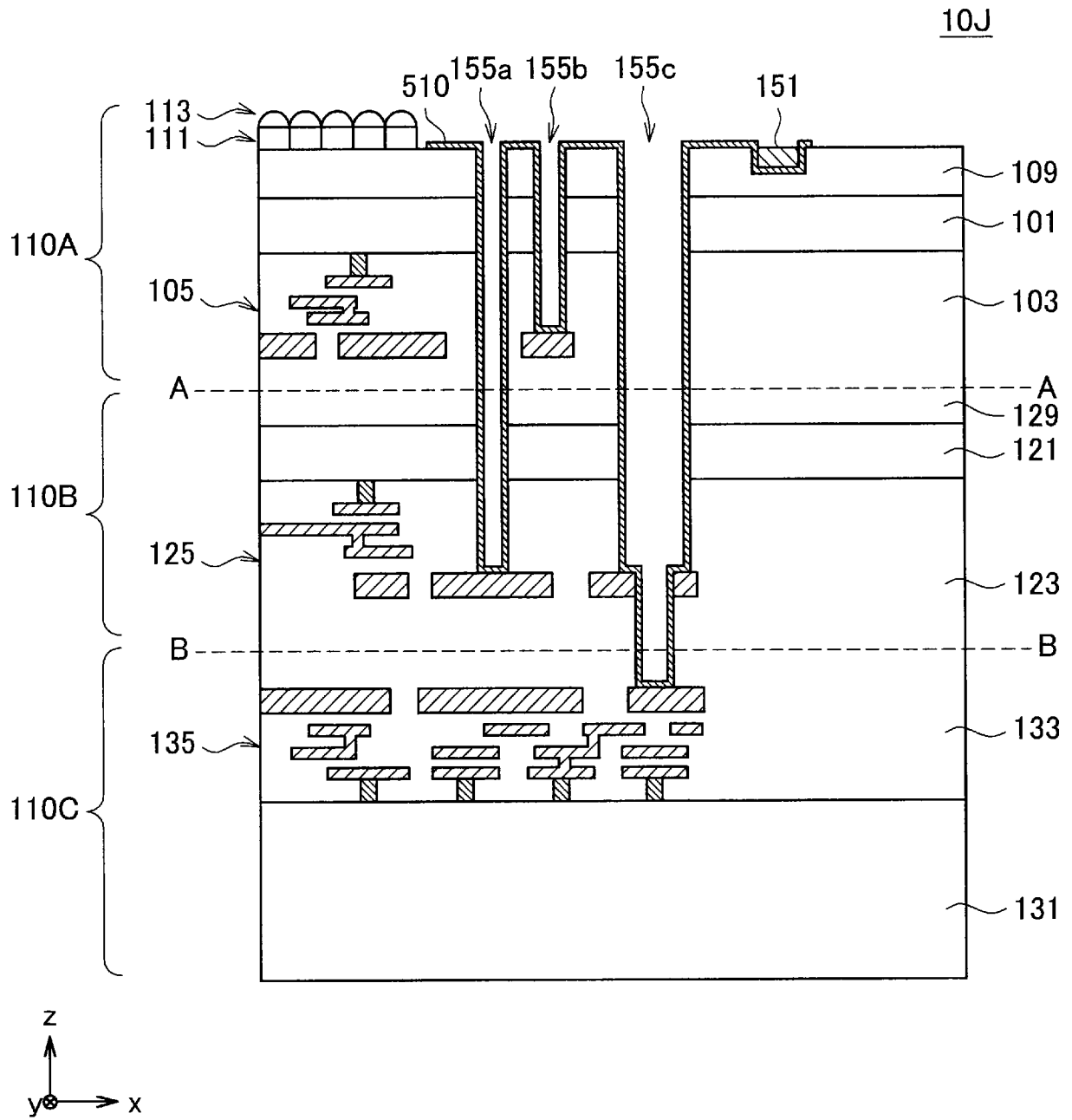
[図10H]



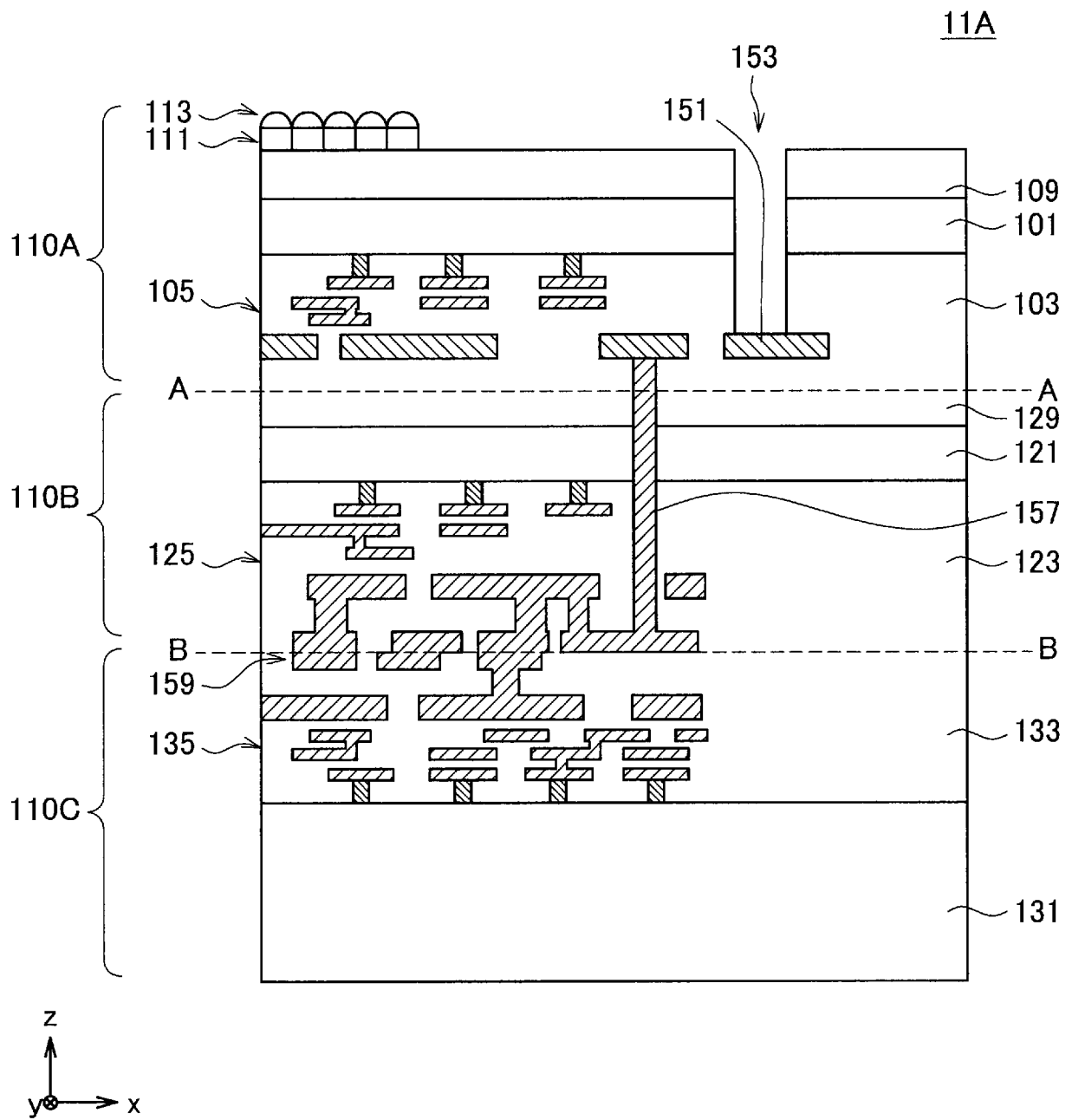
[図10I]



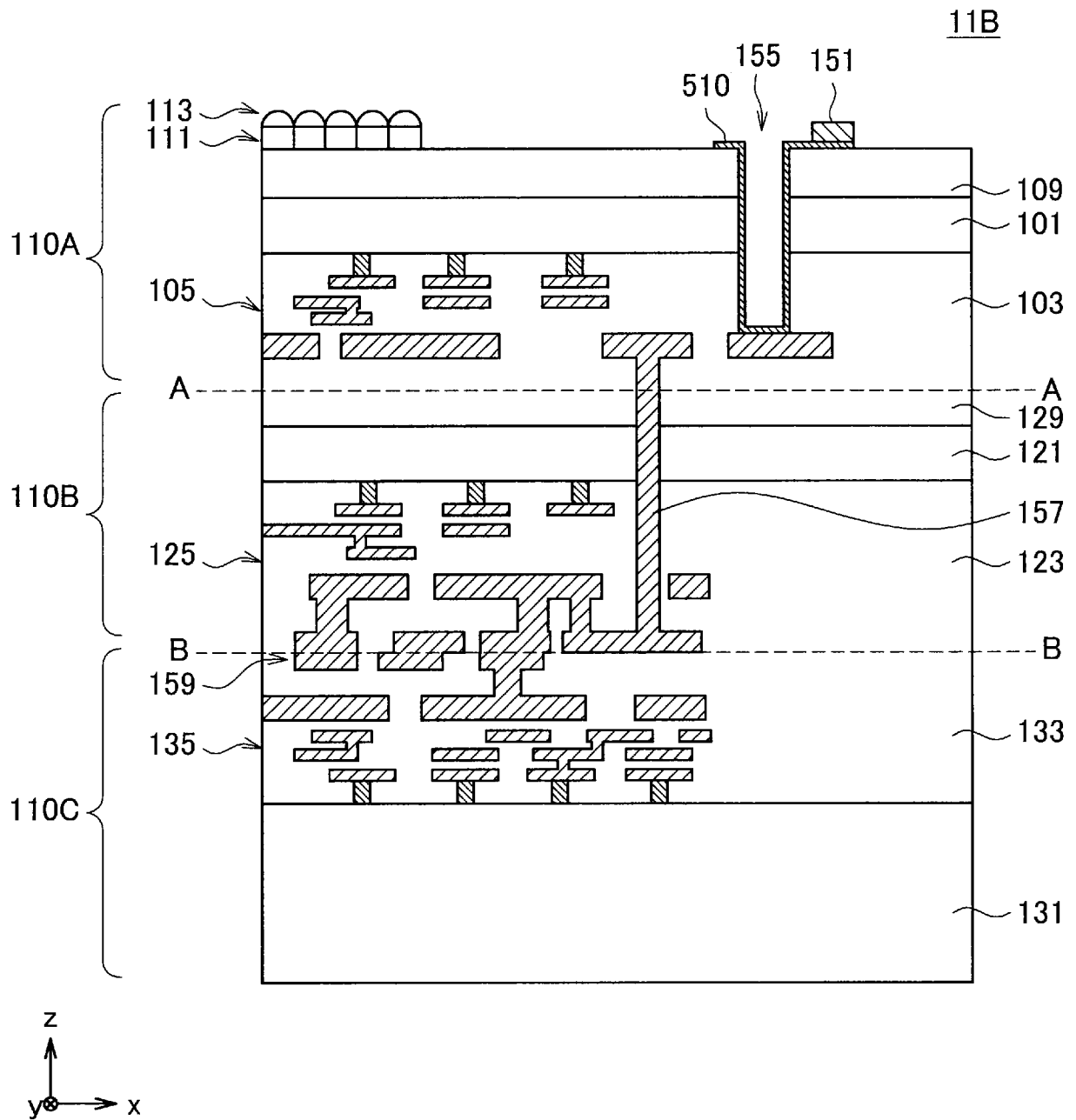
[図10J]



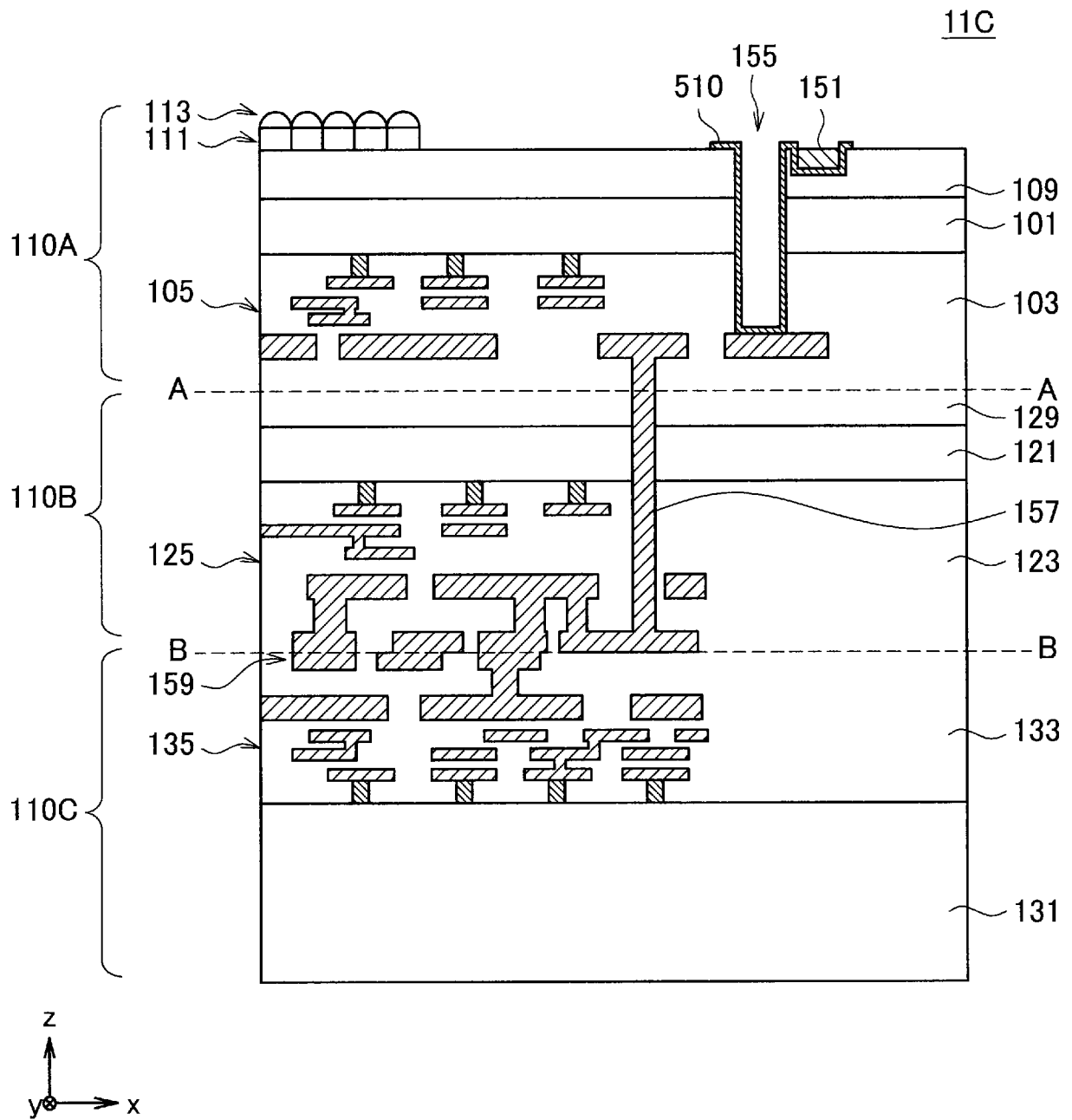
[図11A]



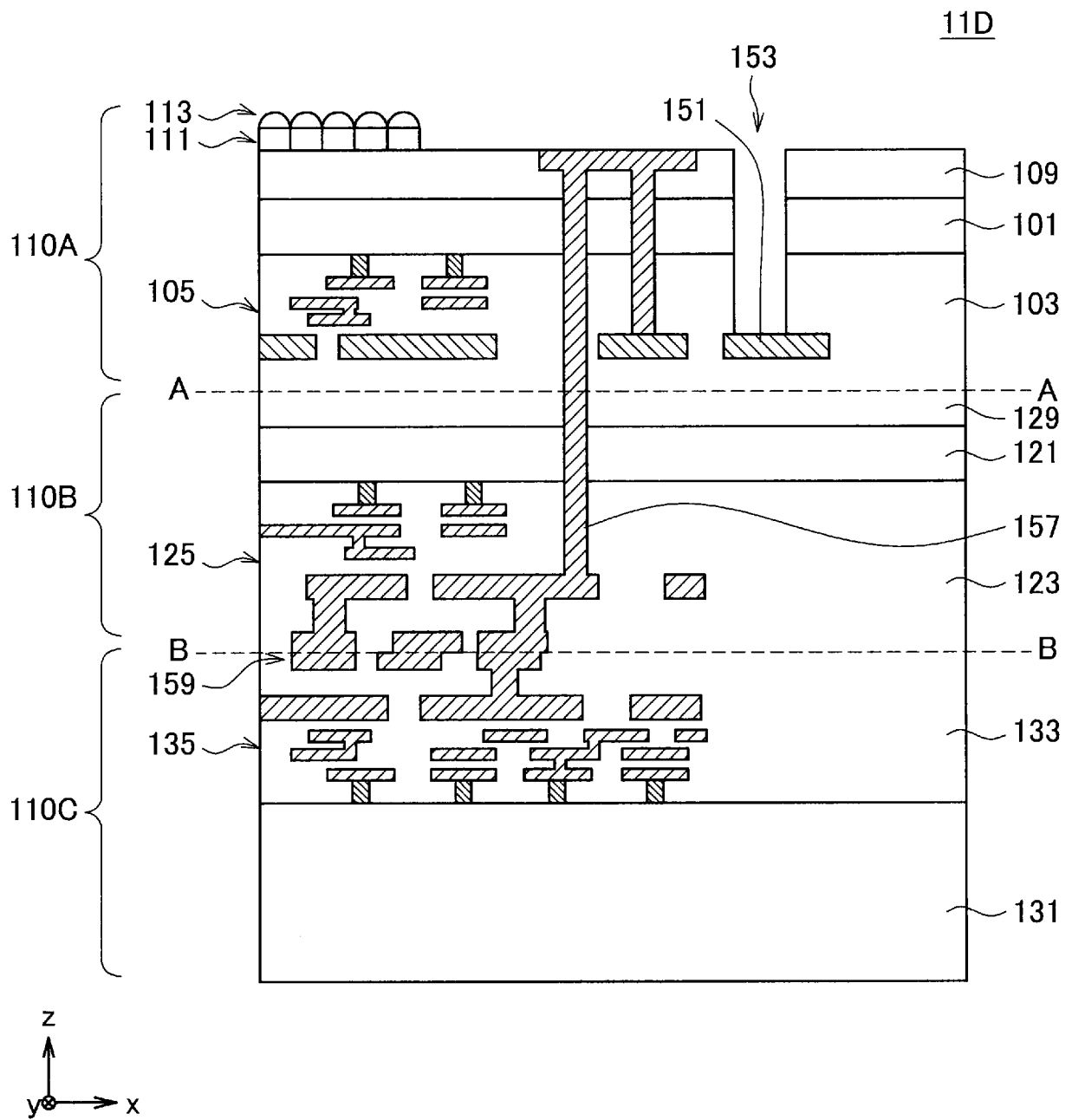
[図11B]



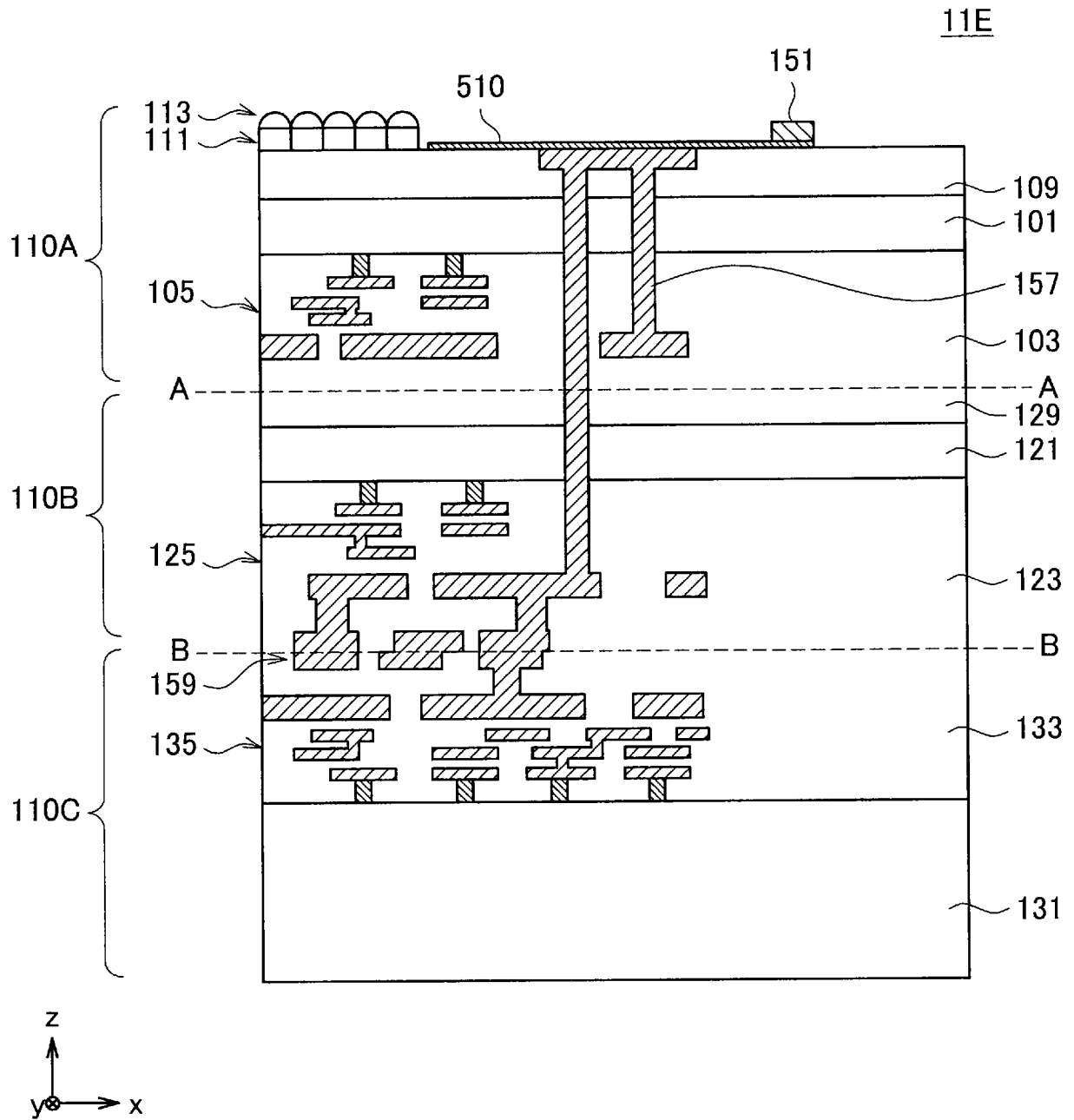
[図11C]



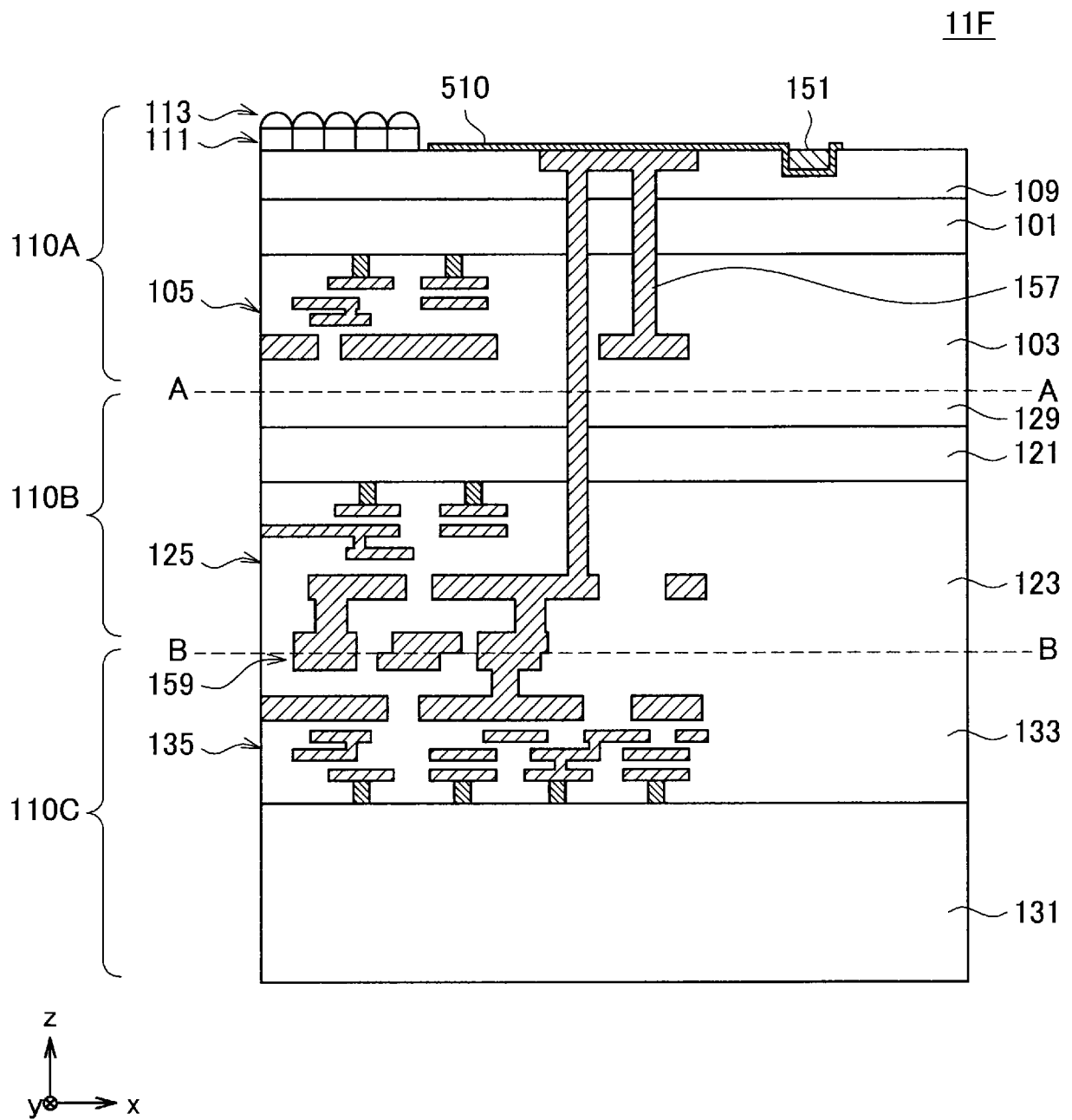
[図11D]



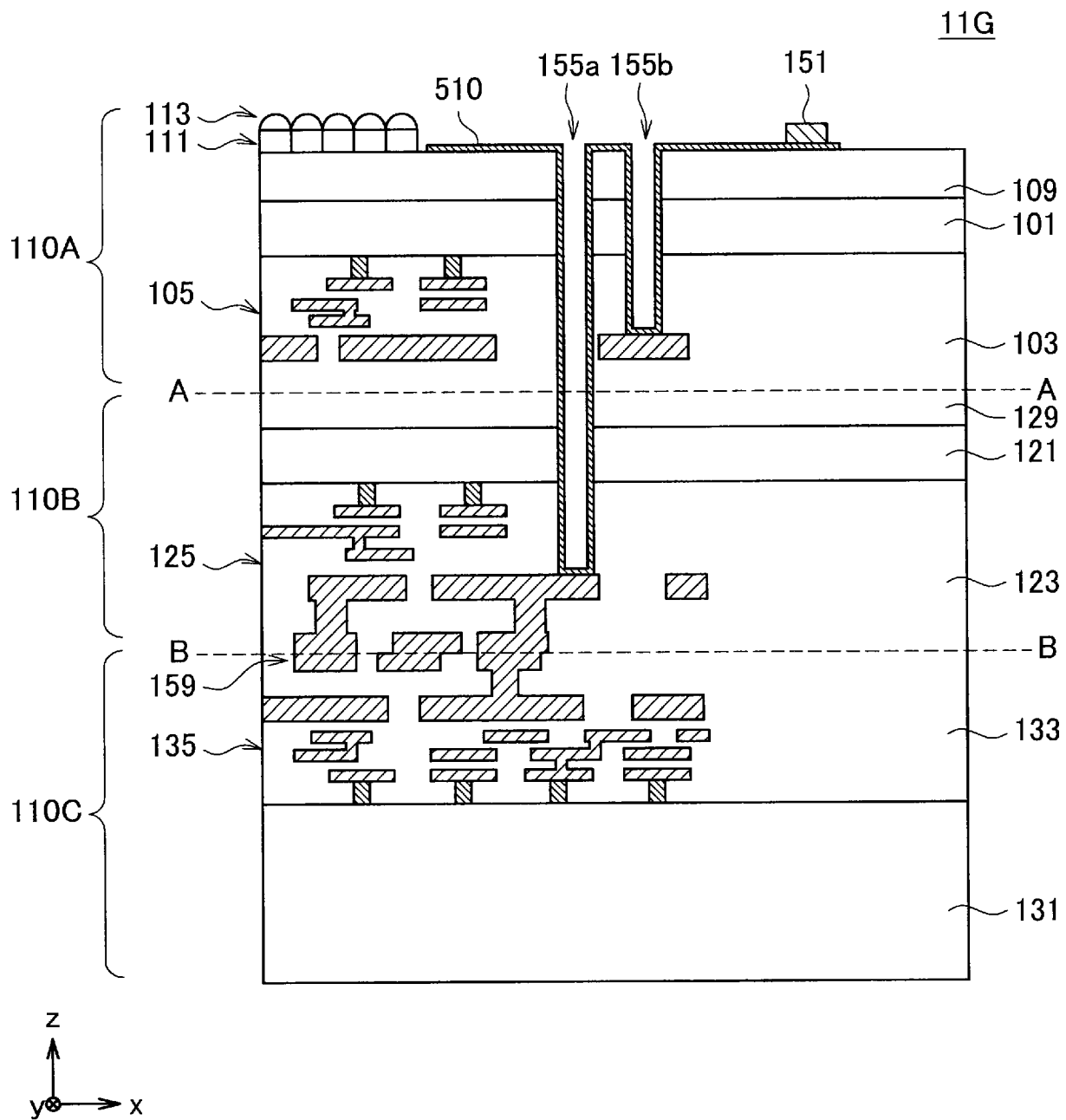
[図11E]



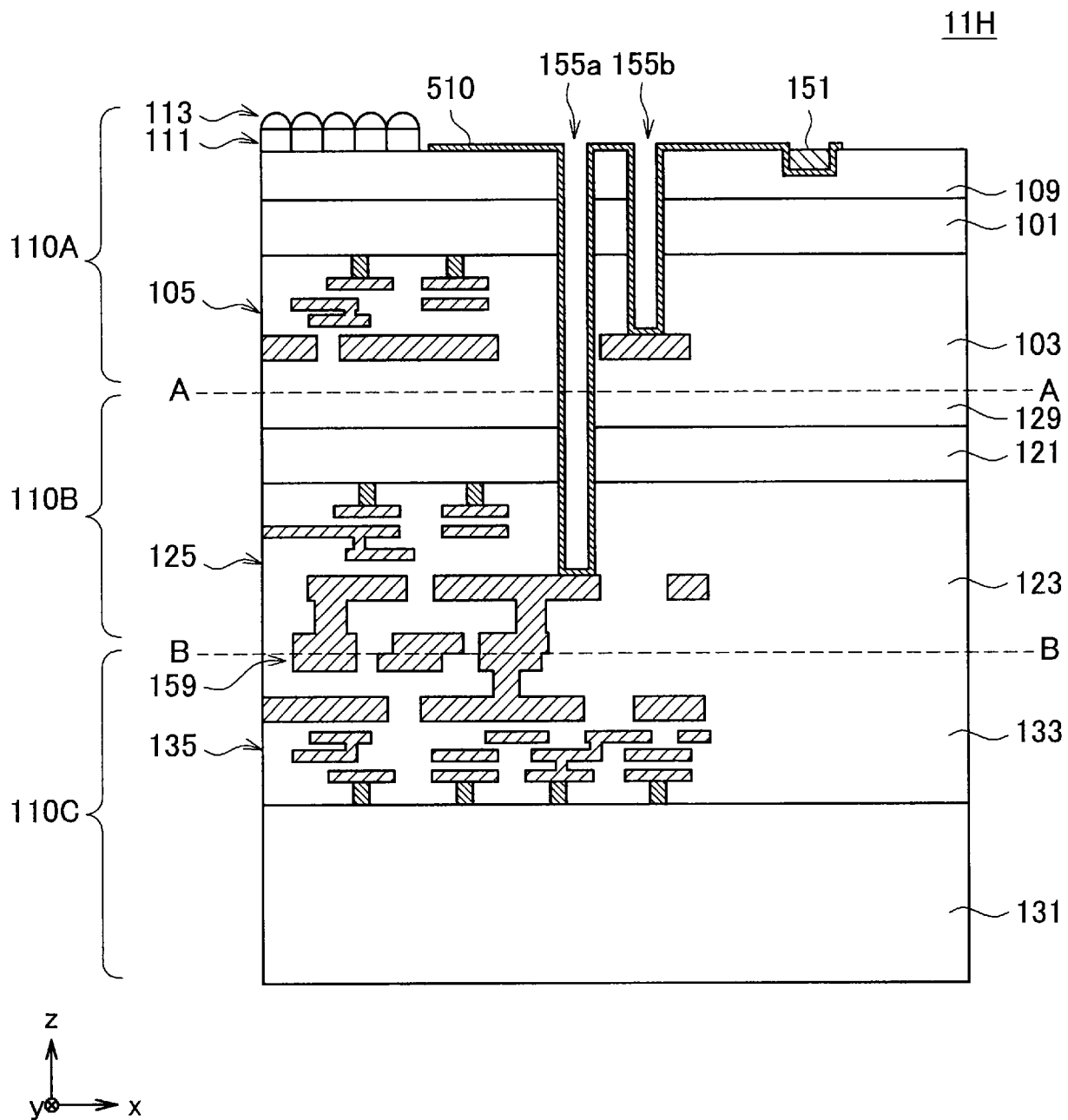
[図11F]



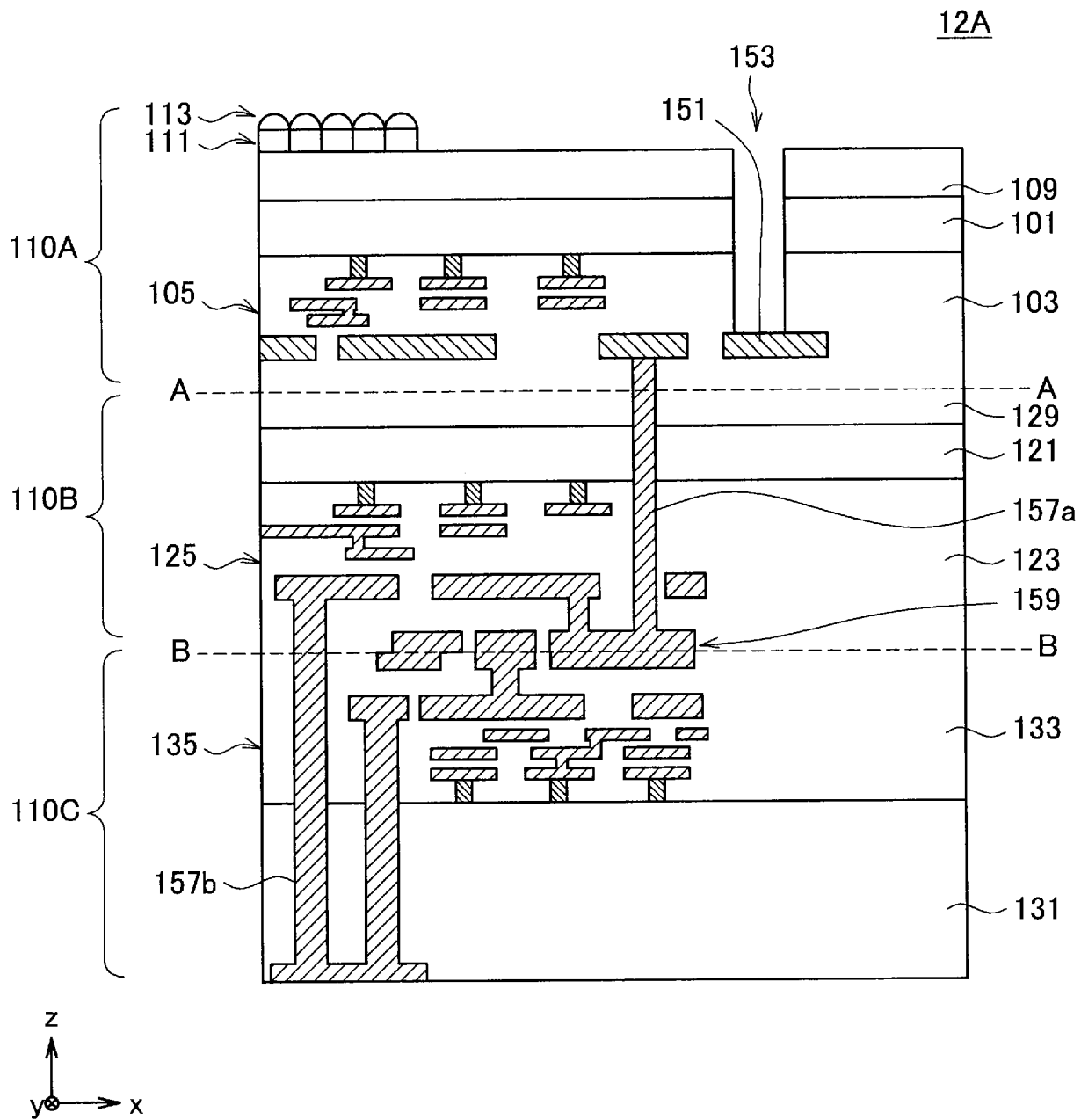
[図11G]



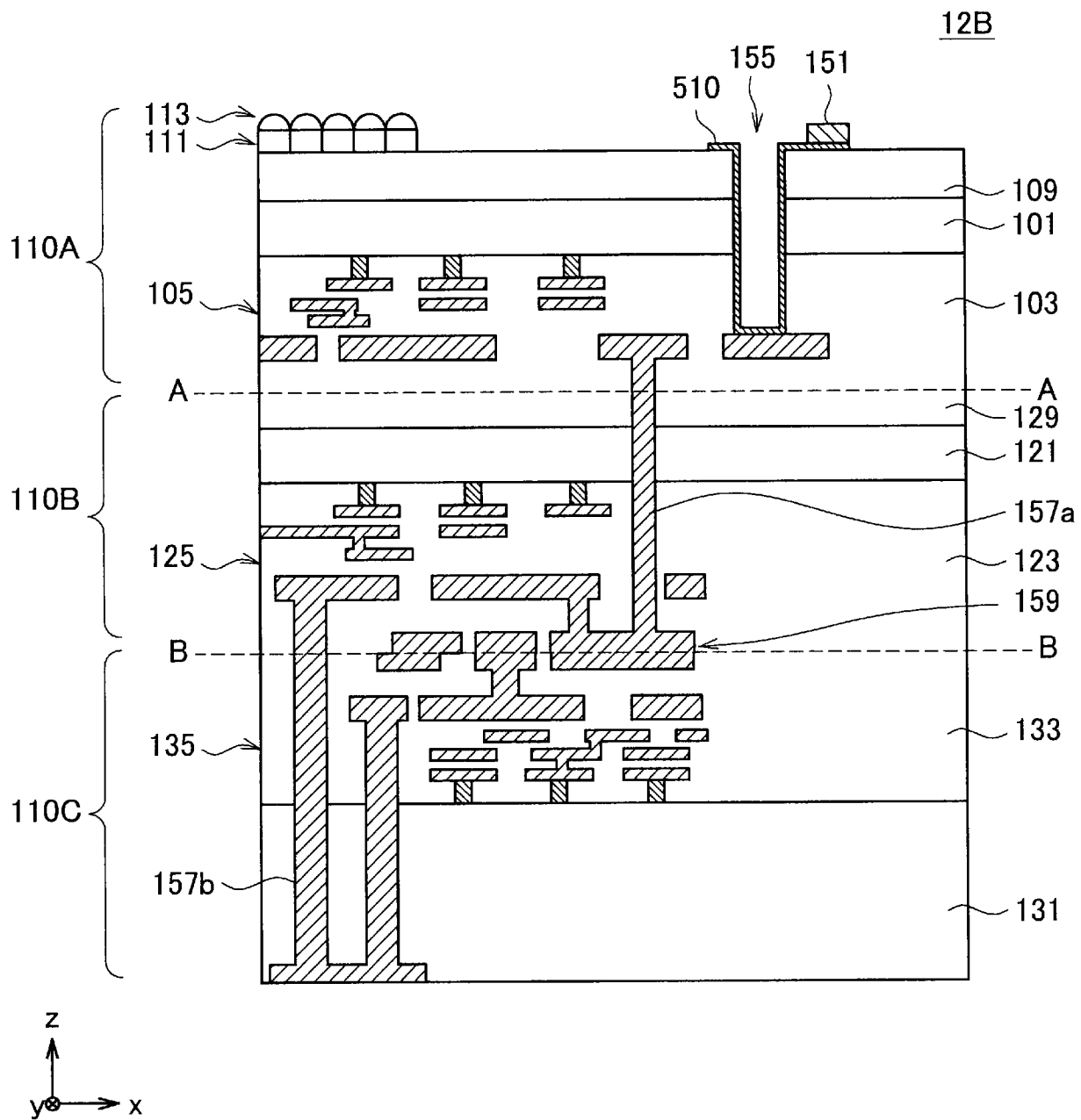
[図11H]



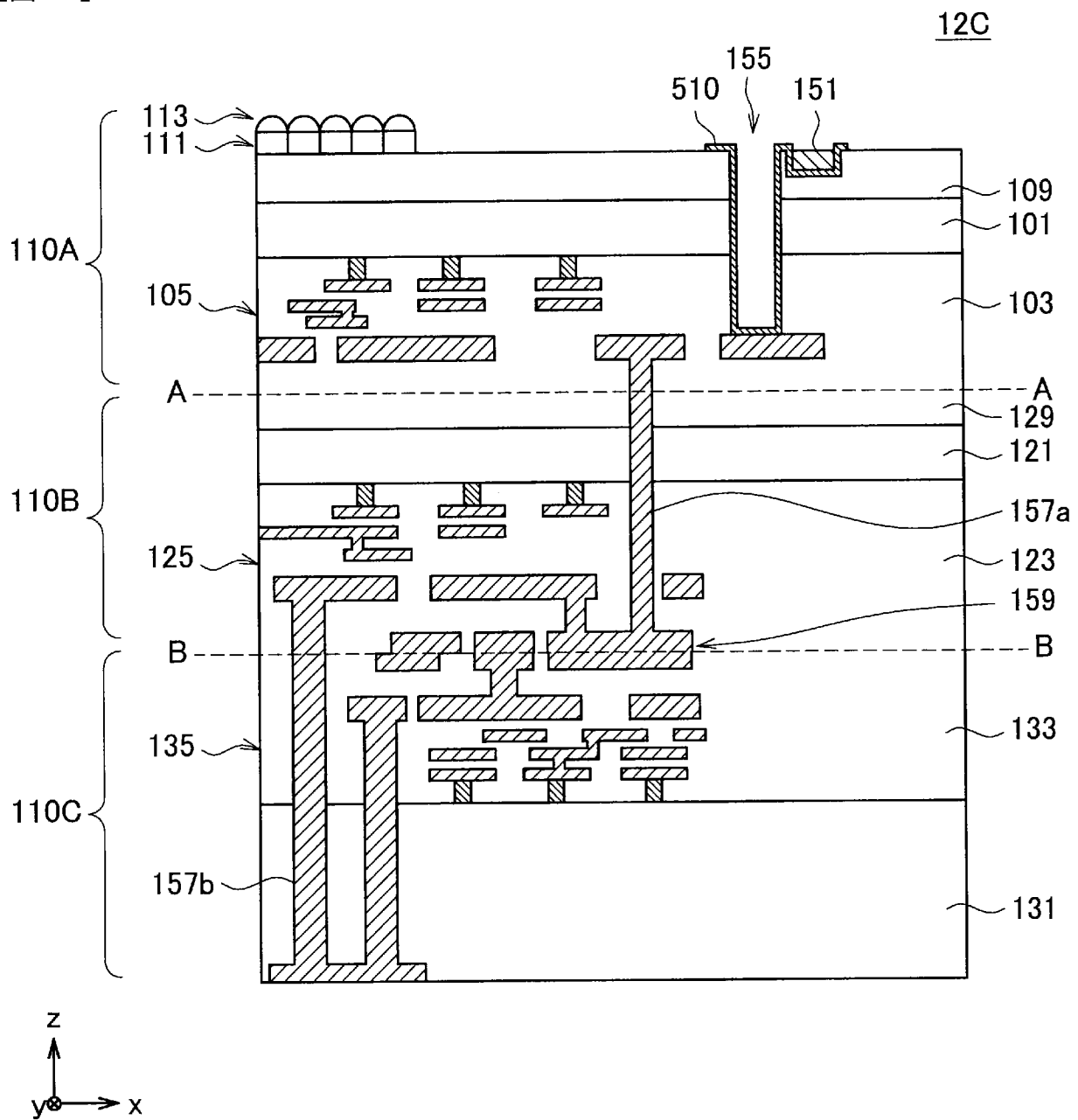
[図12A]



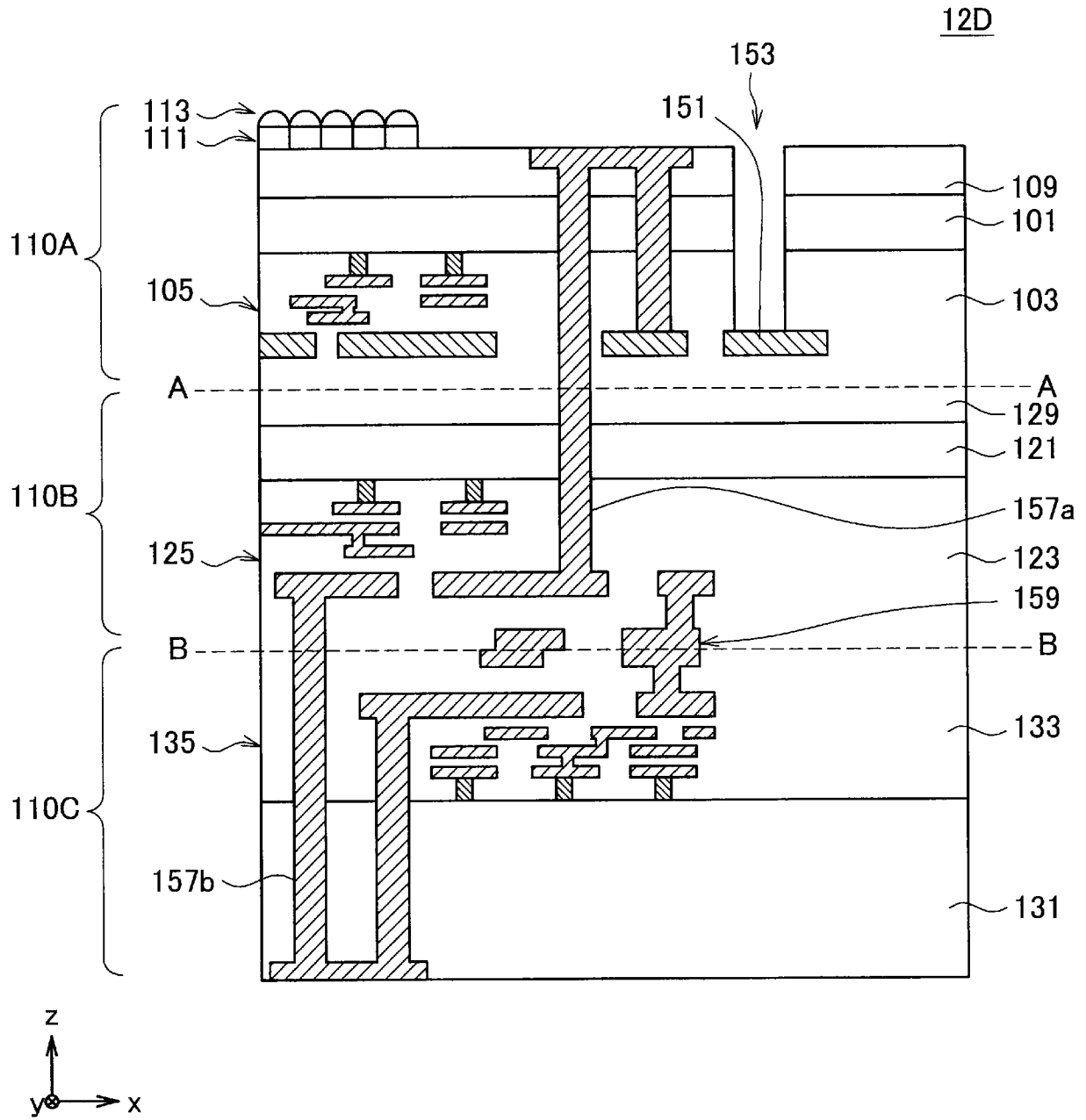
[図12B]



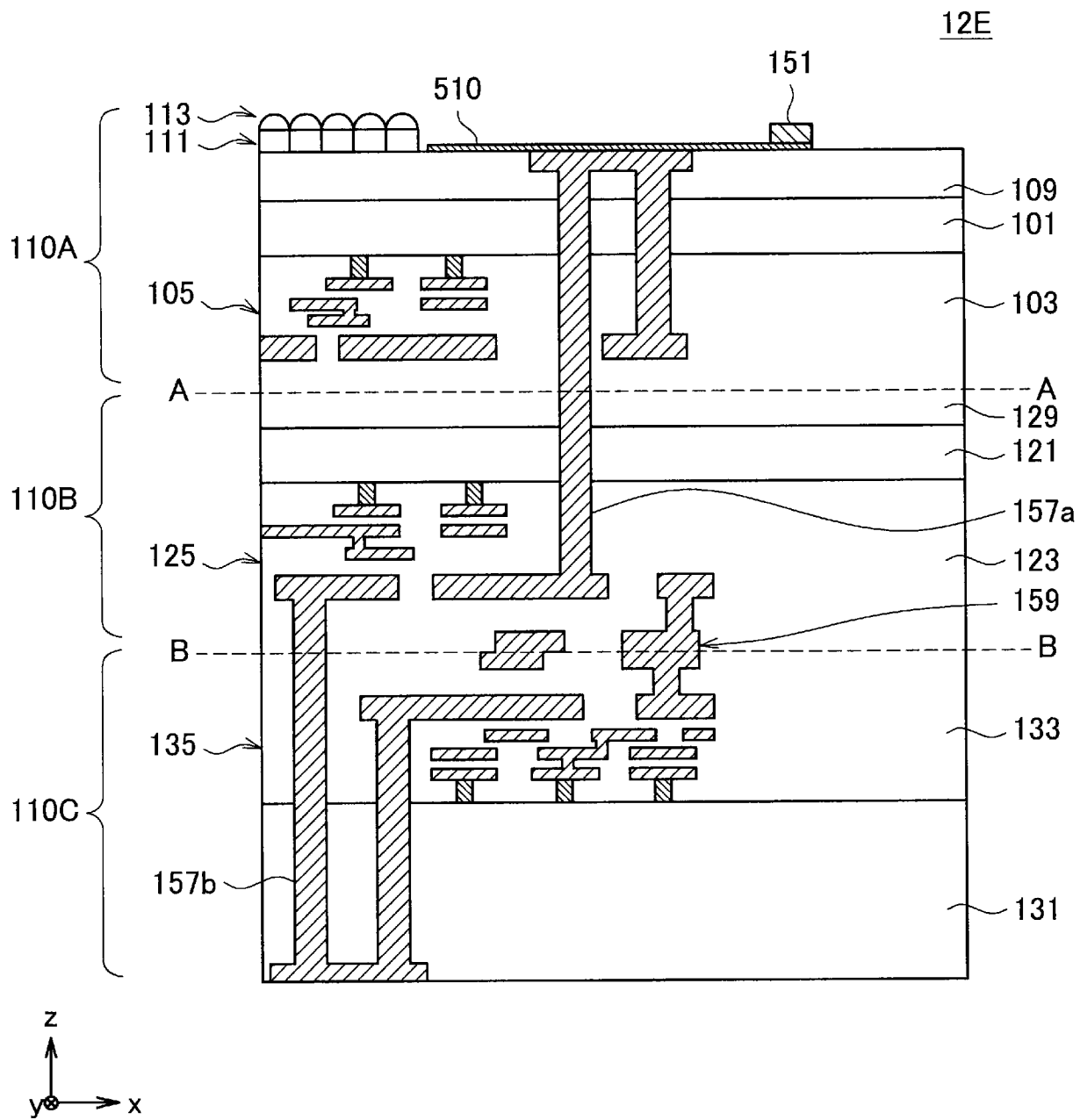
[図12C]



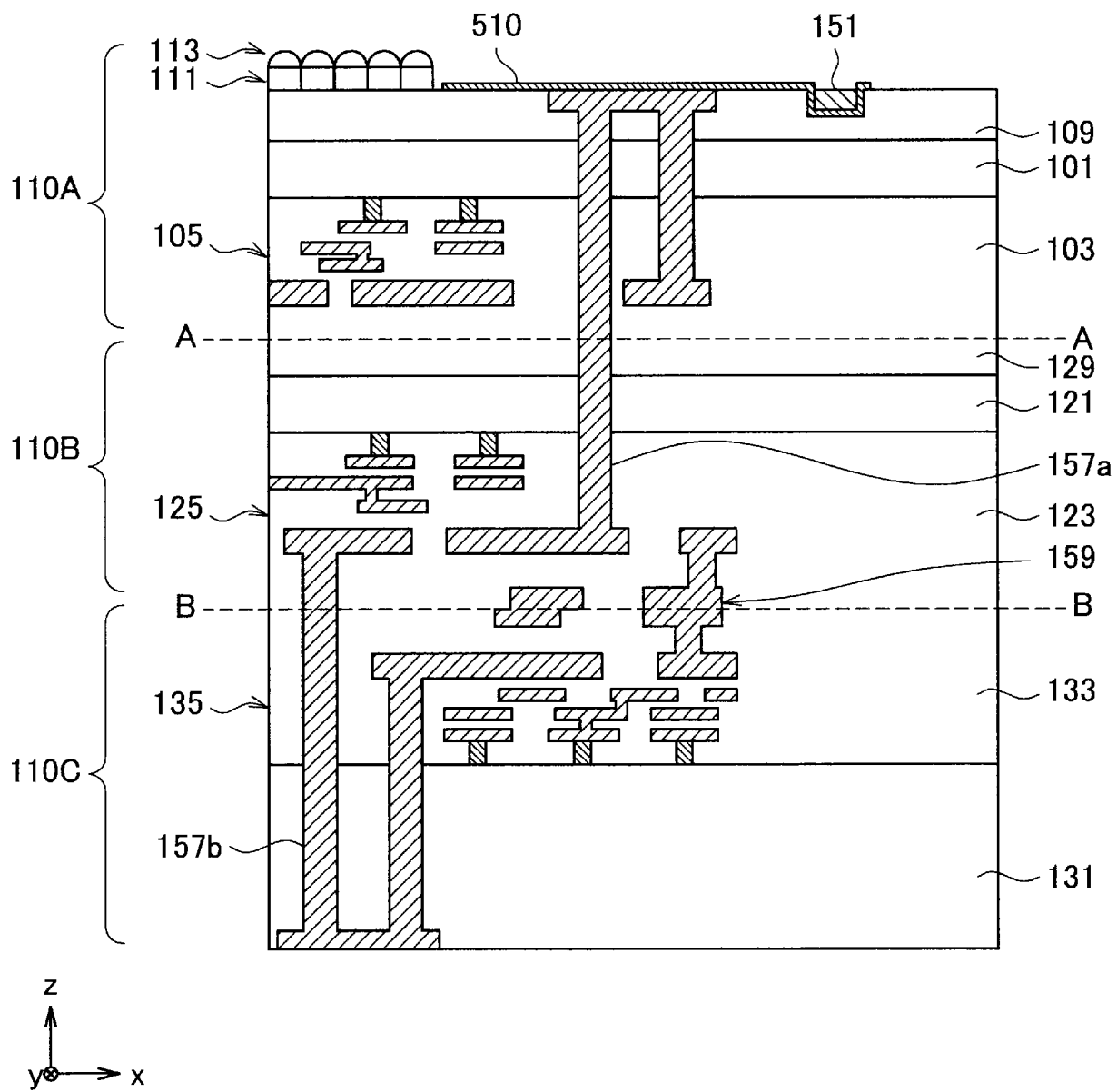
[図12D]



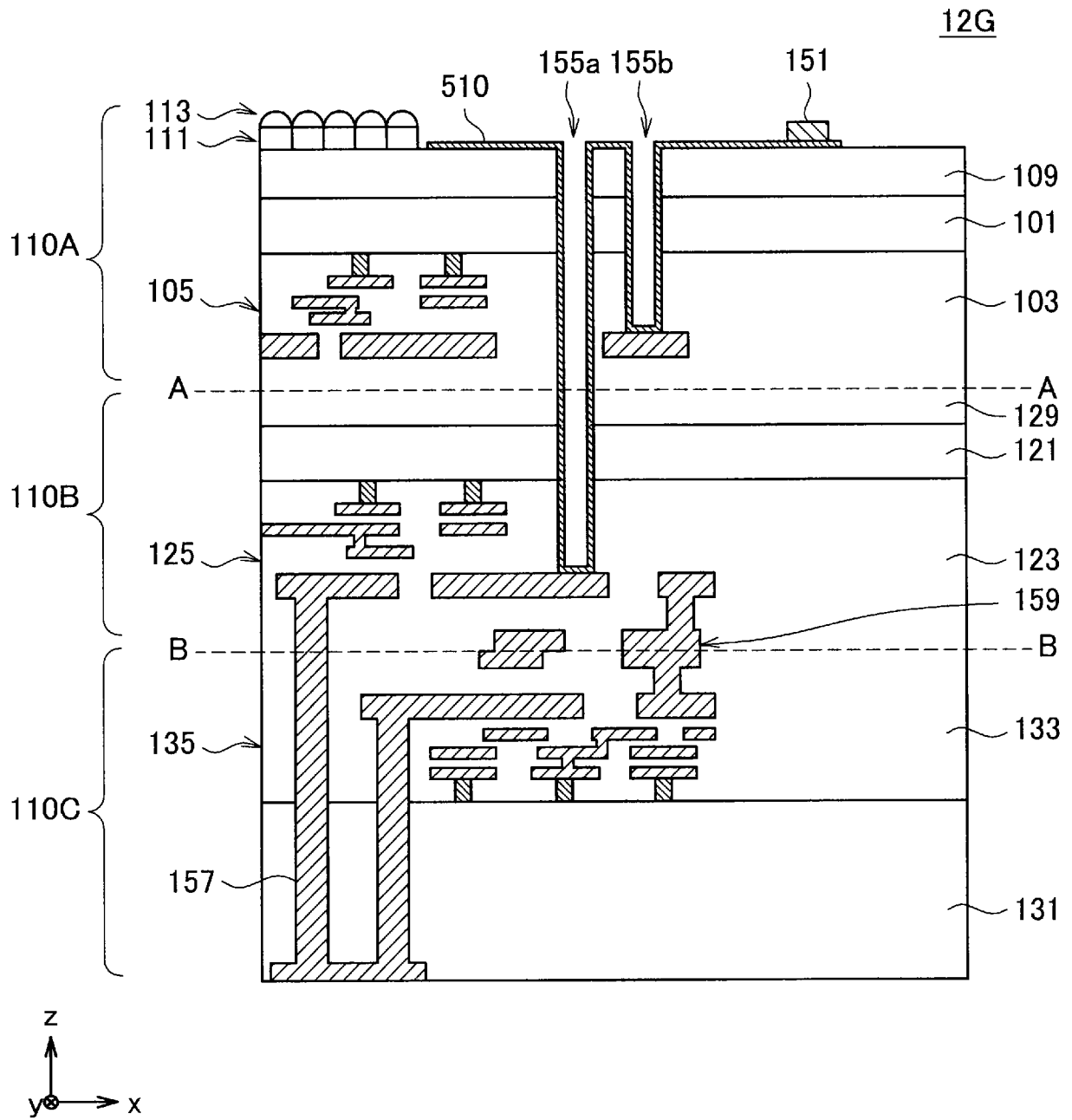
[図12E]



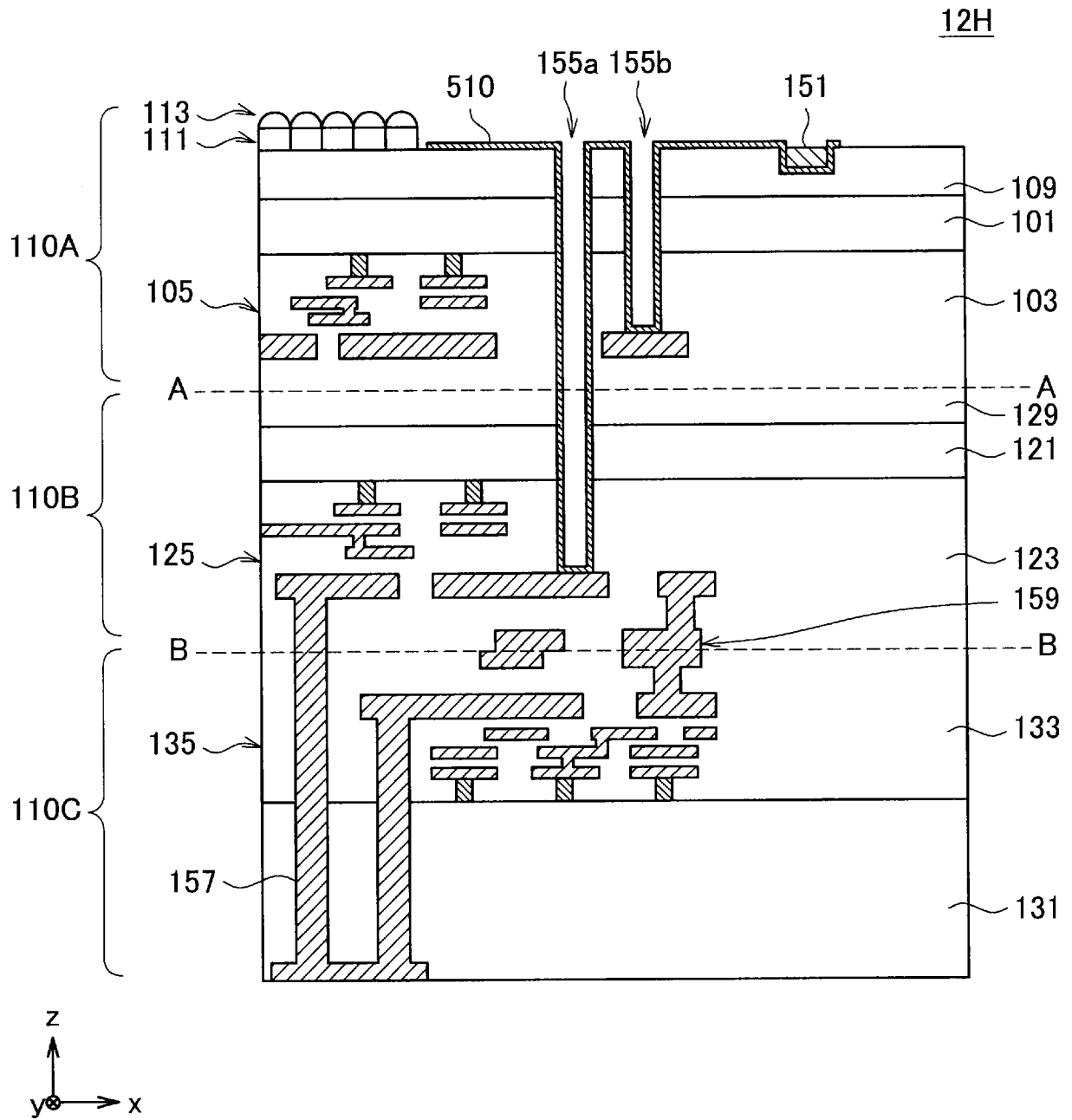
[図12F]

12F

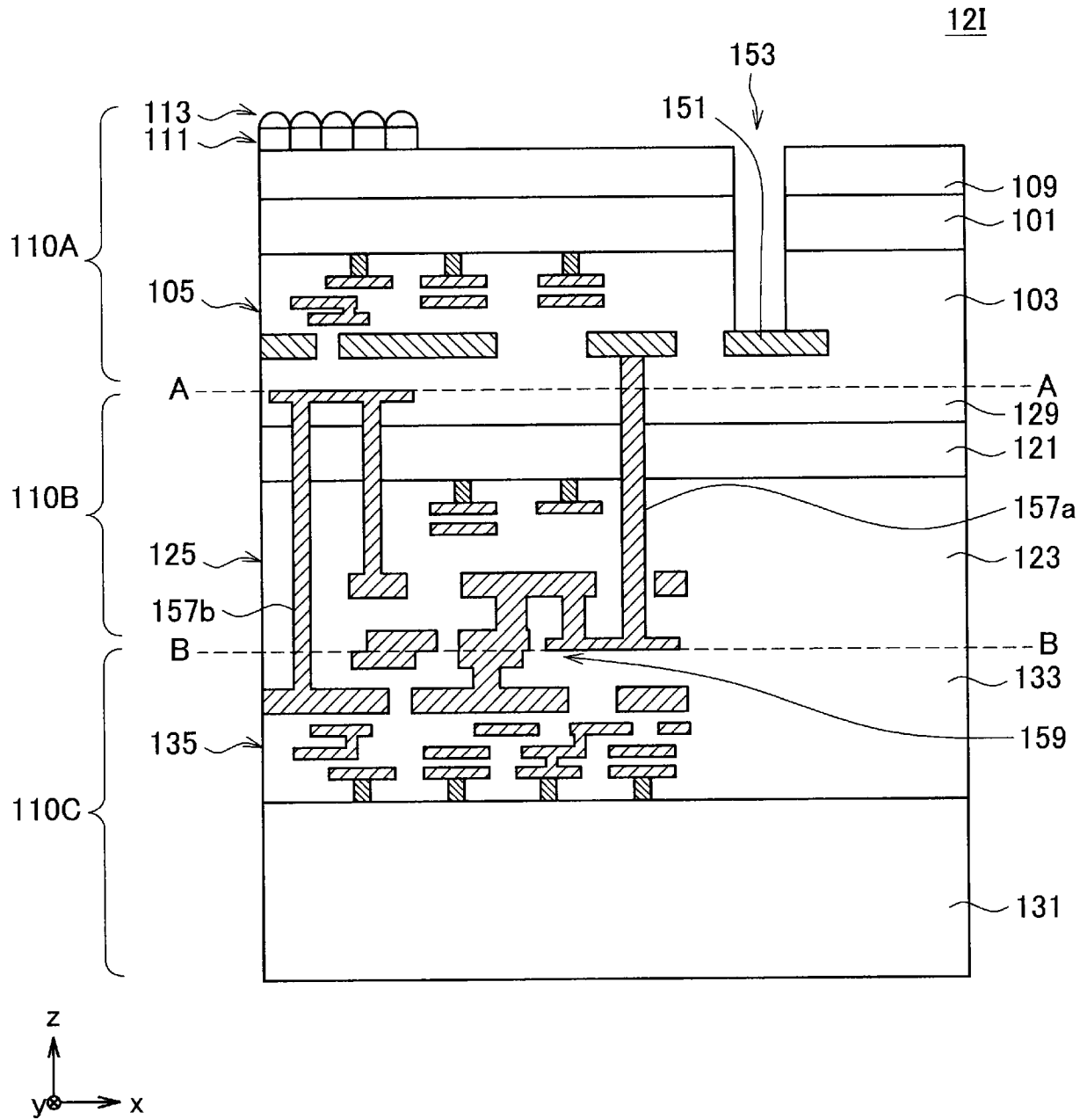
[図12G]



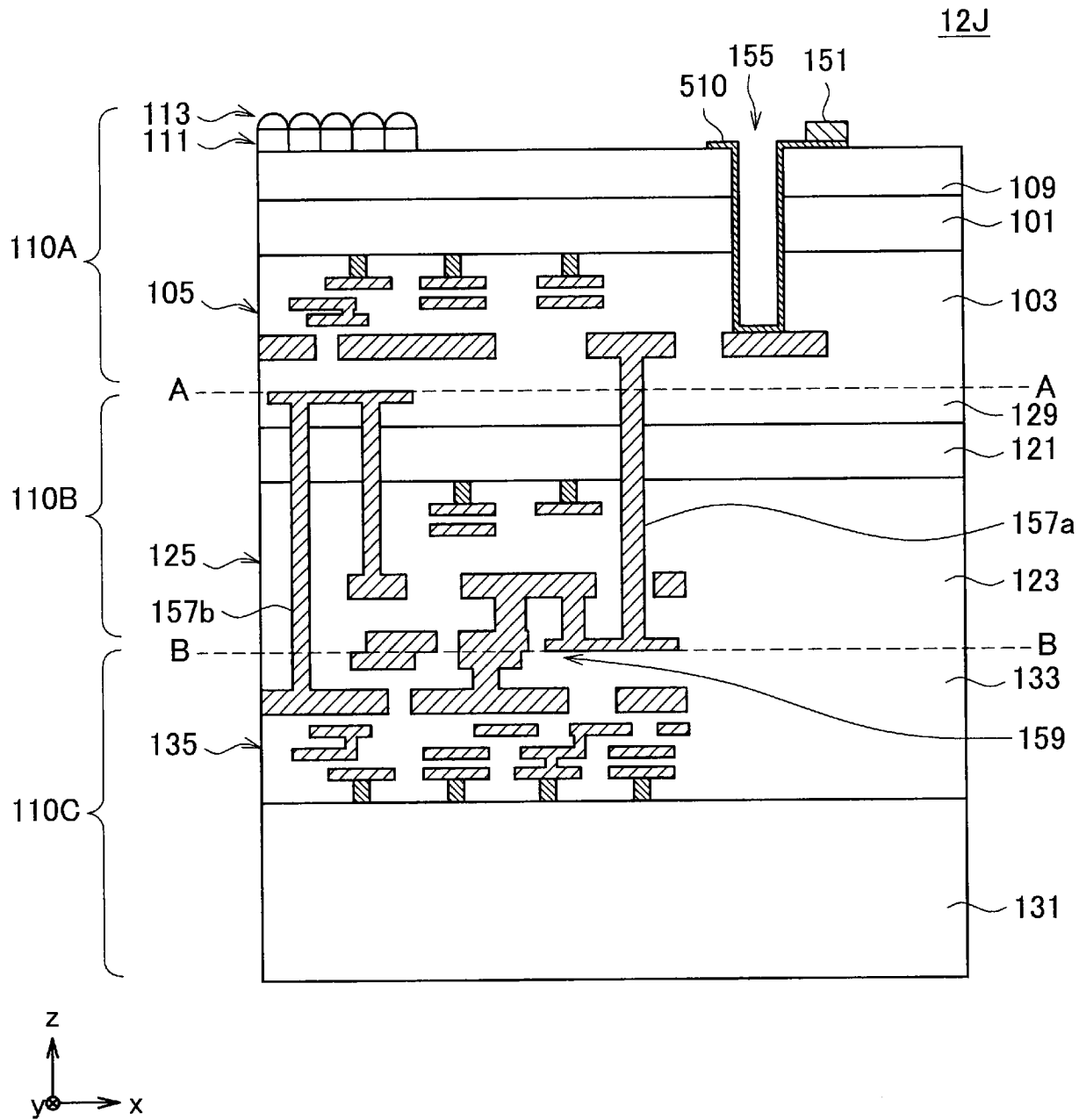
[図12H]



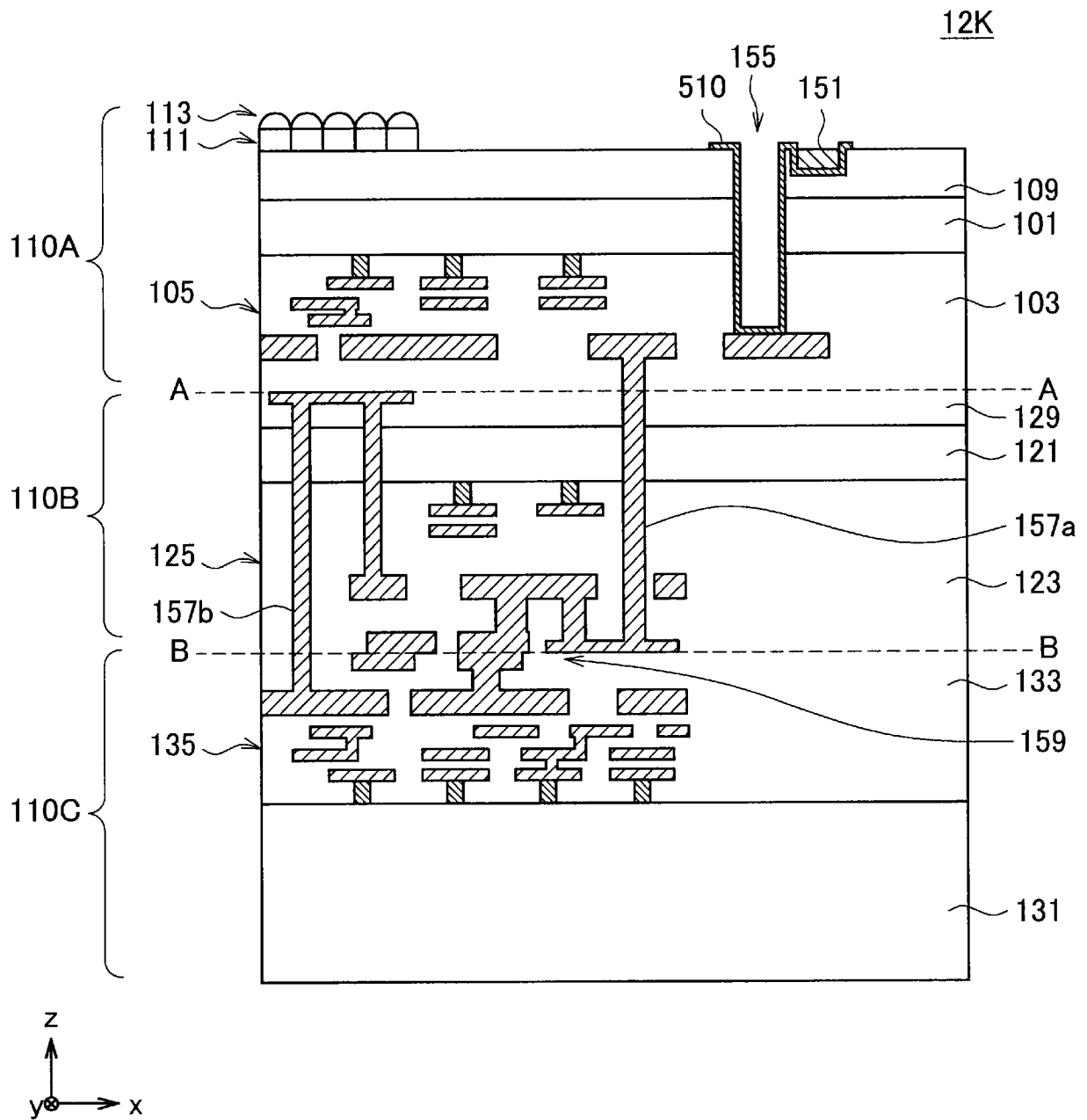
[図12I]



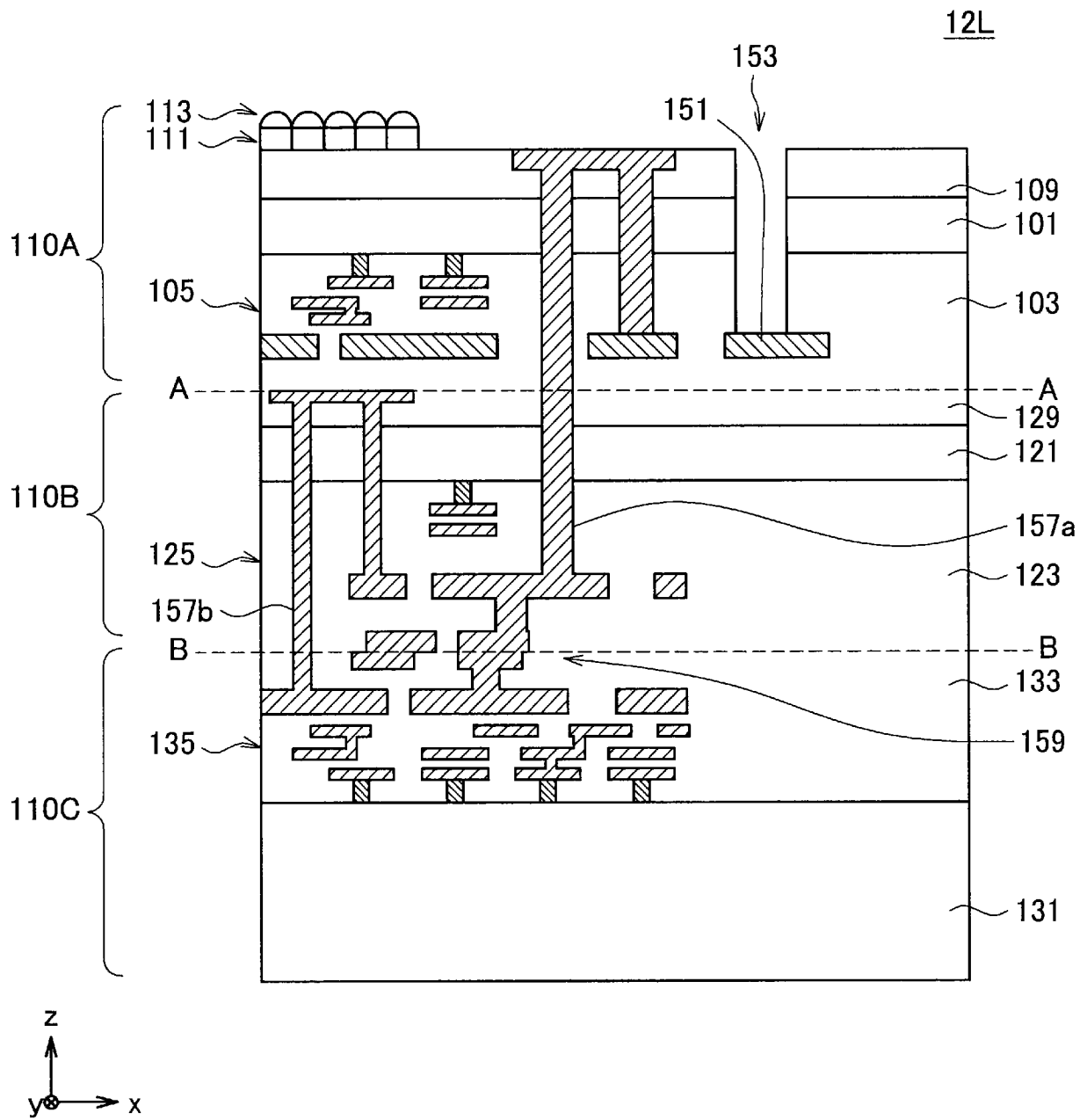
[図12J]



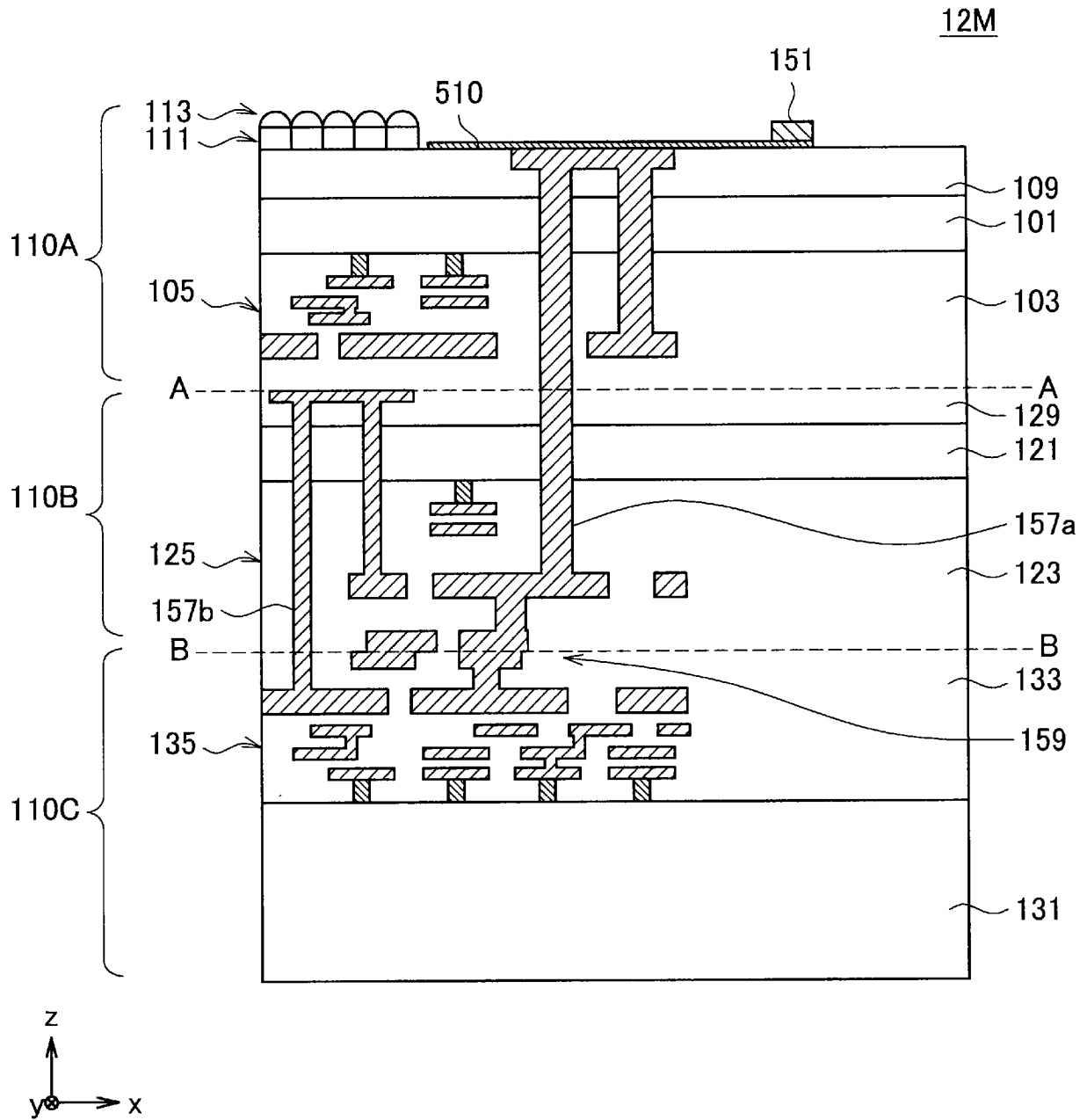
[図12K]



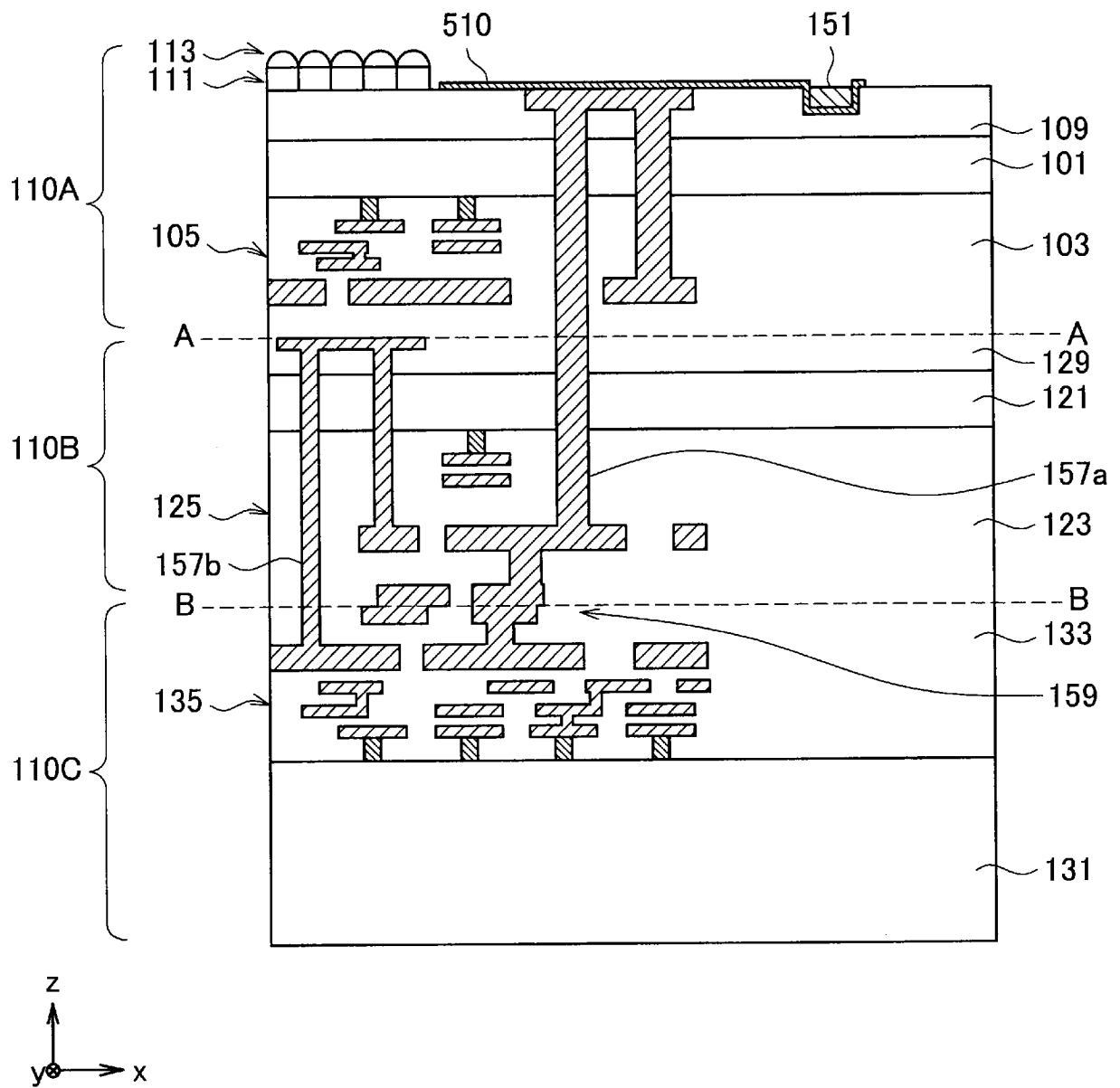
[図12L]



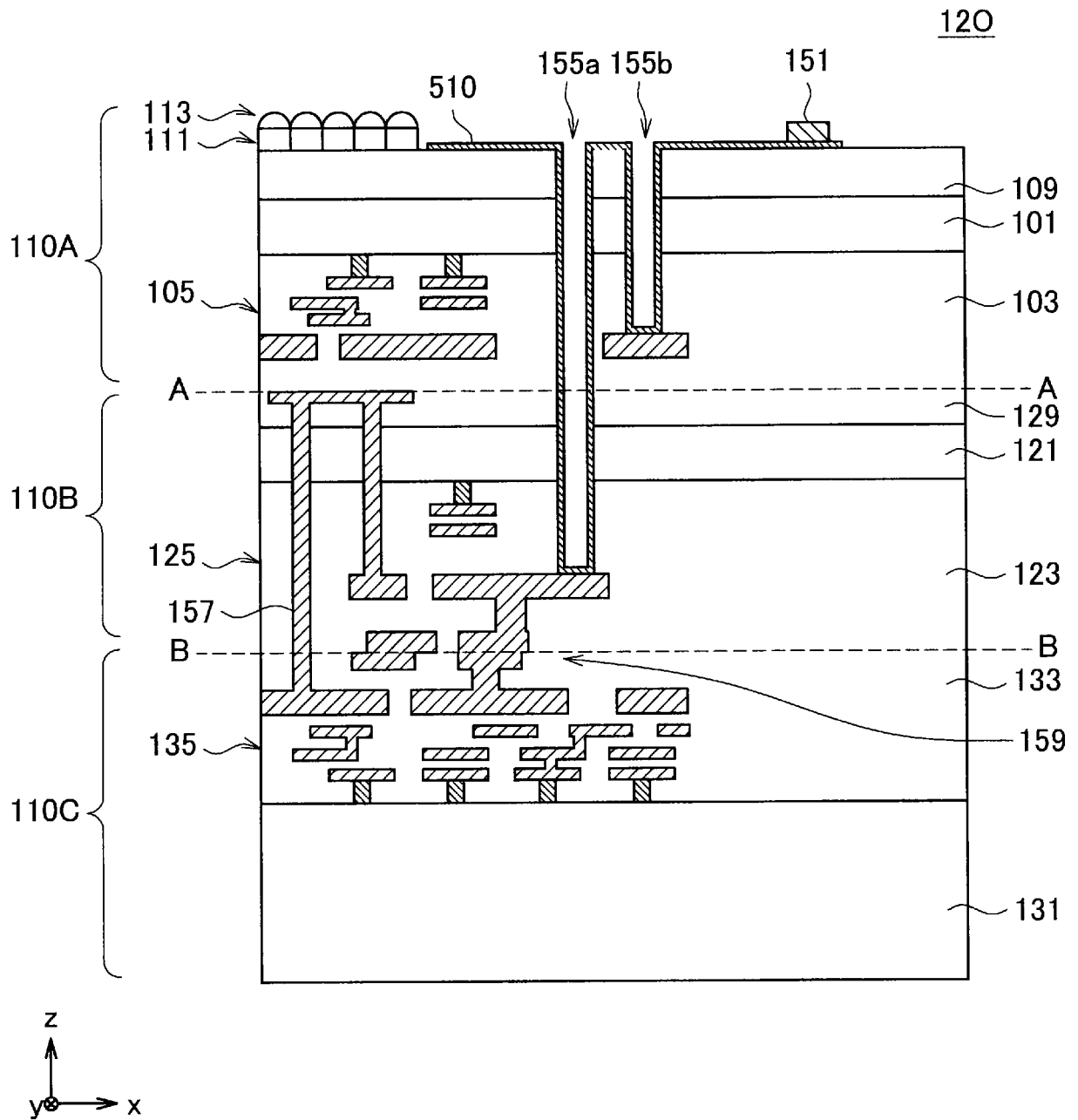
[図12M]



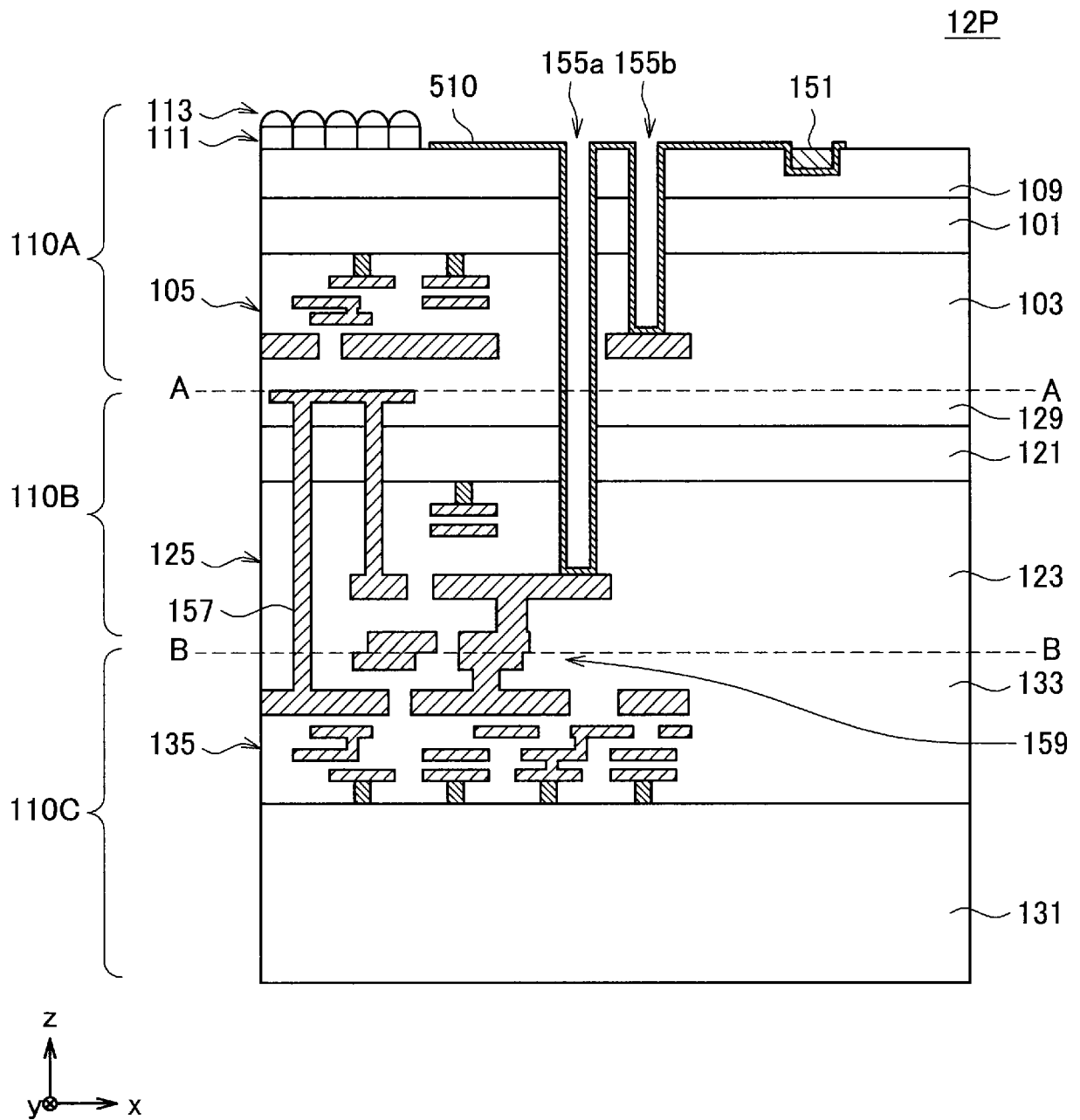
[図12N]

12N

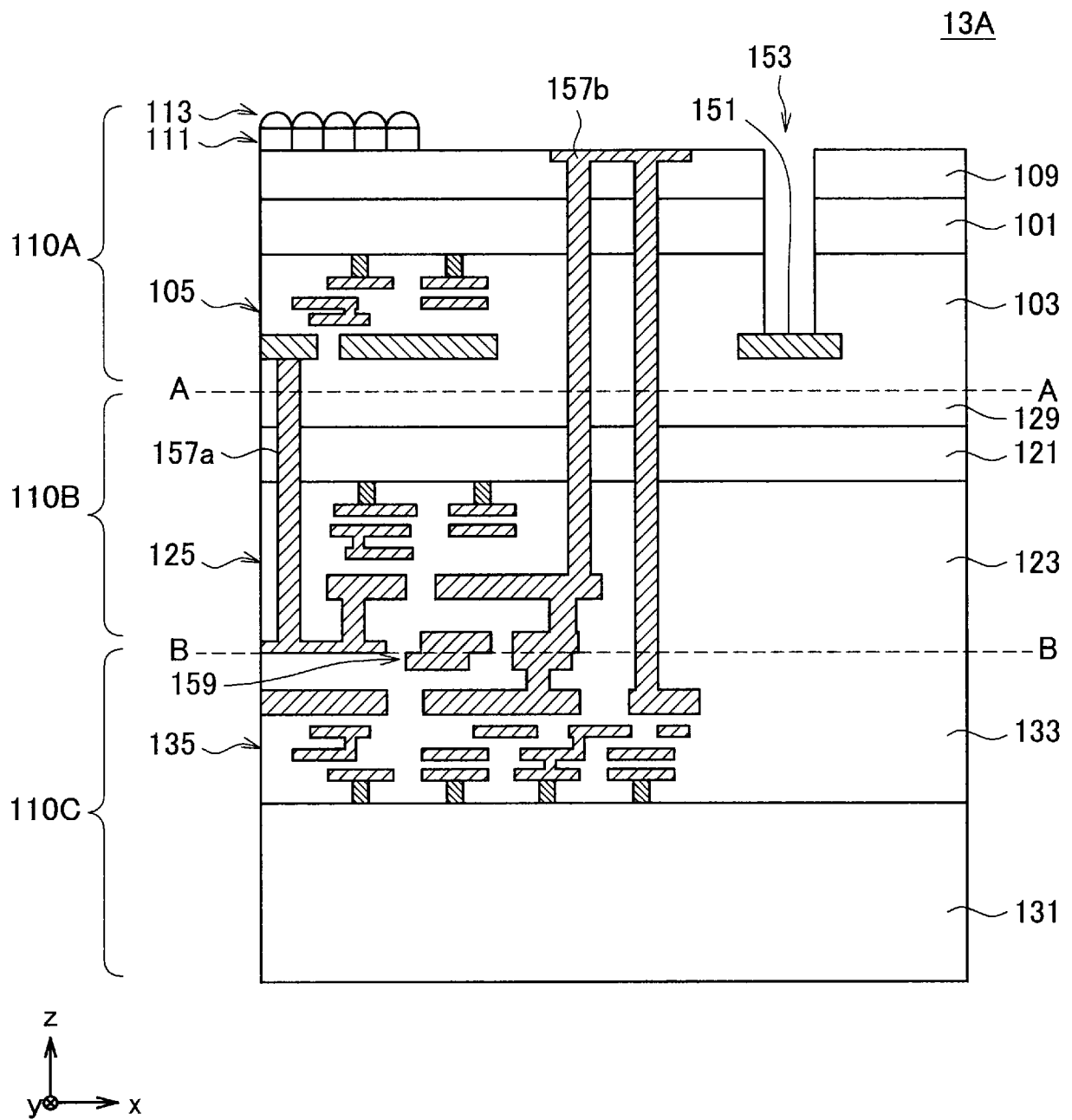
[図120]



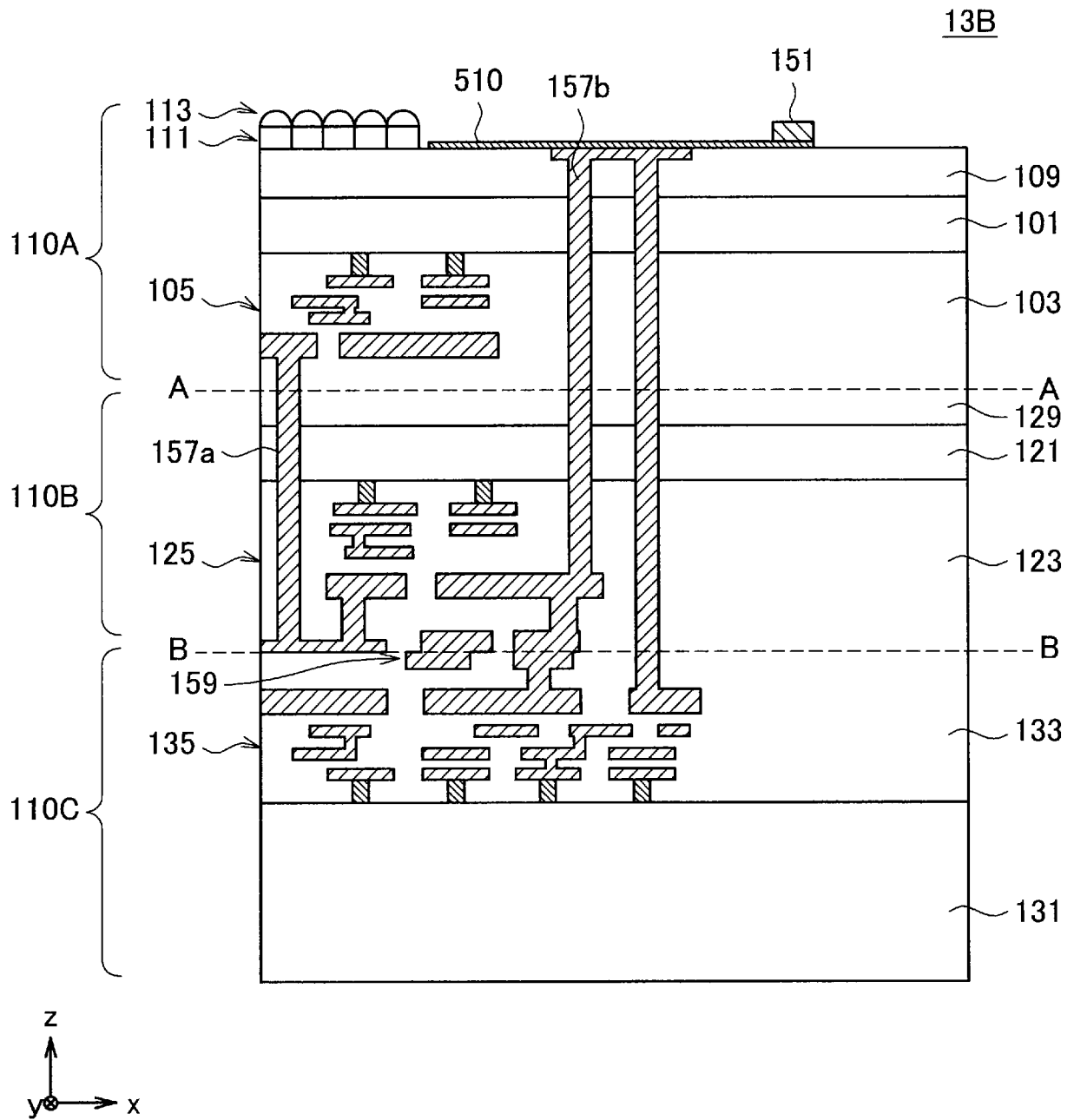
[図12P]



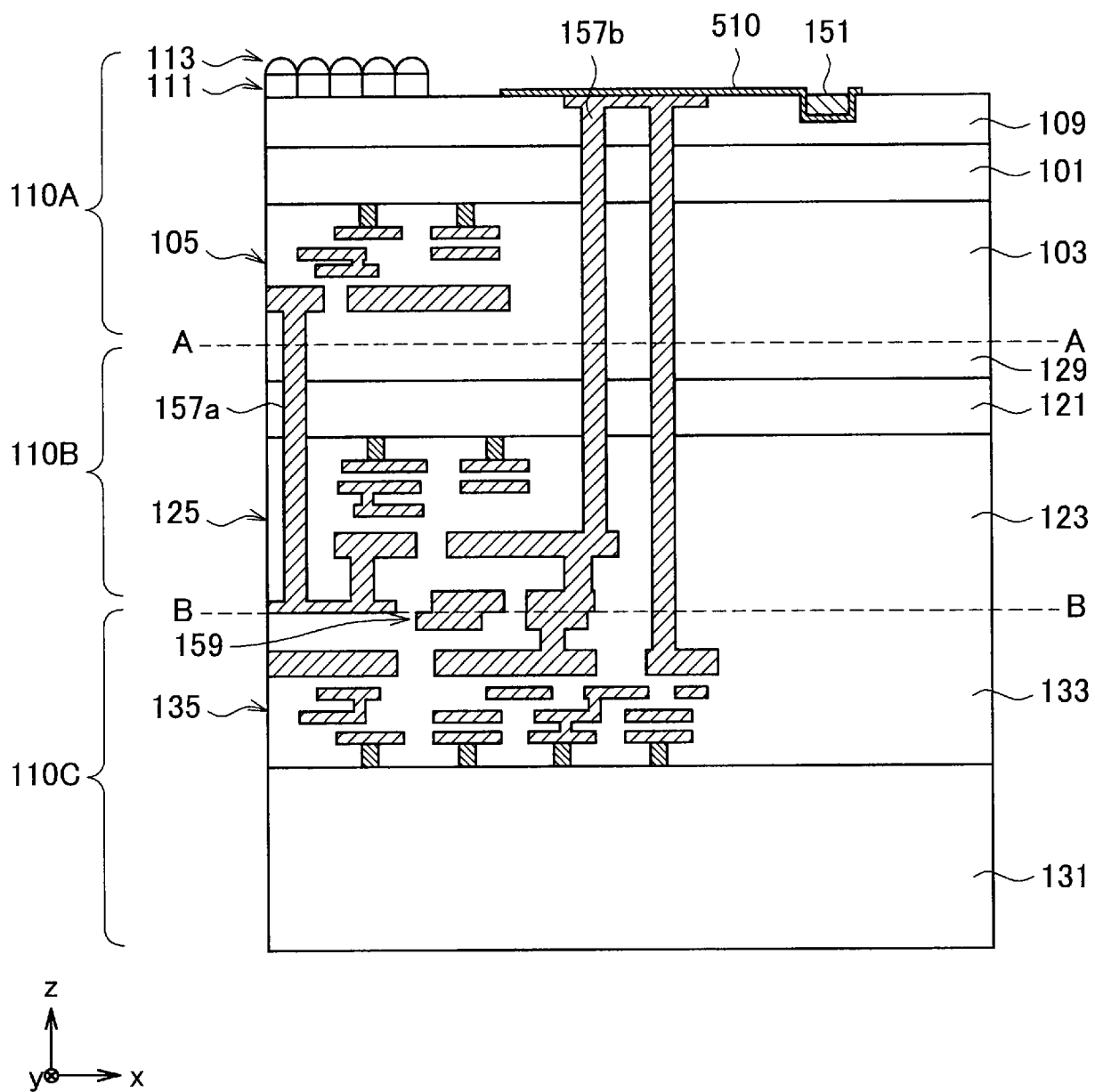
[図13A]



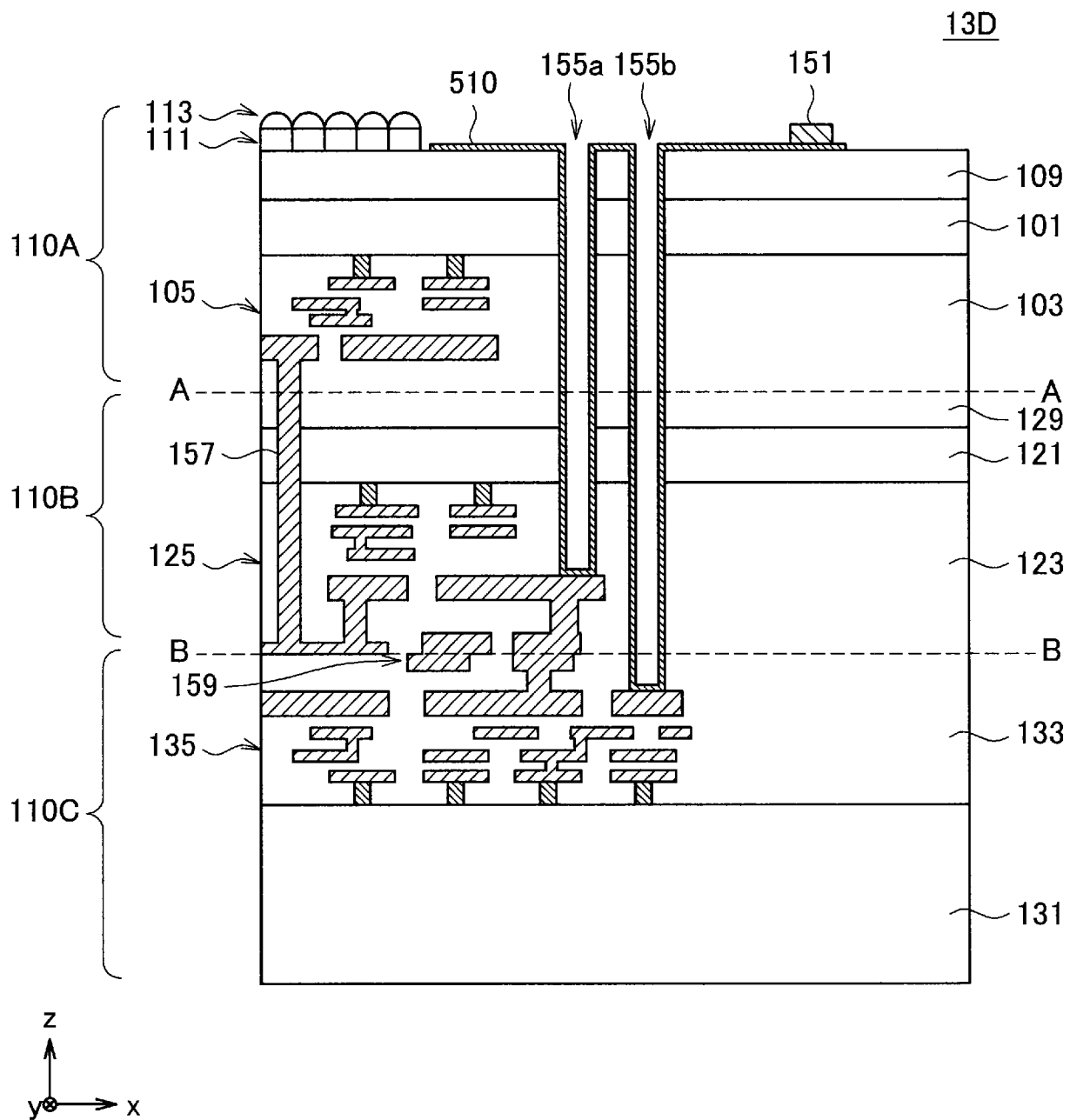
[図13B]



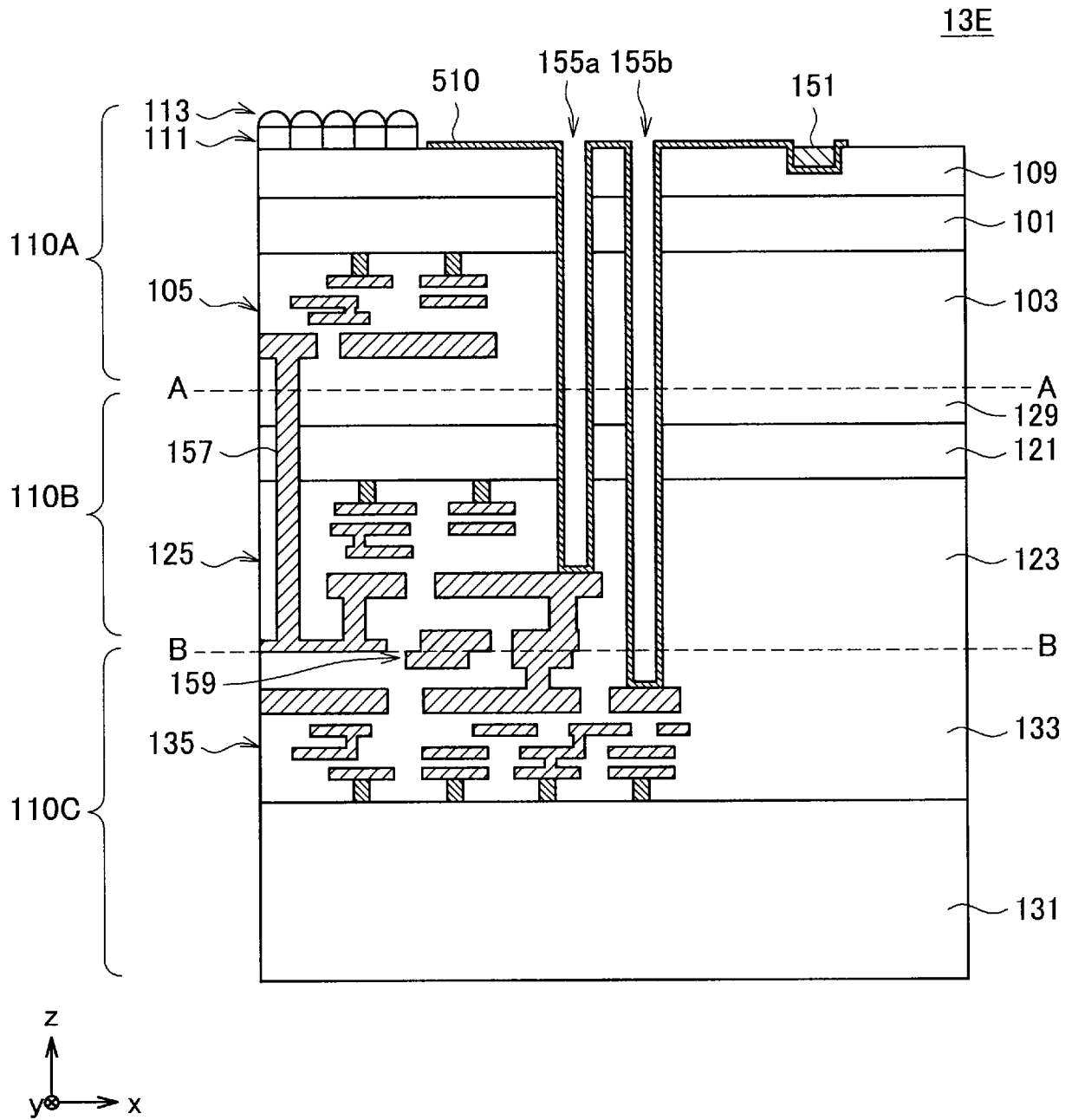
[図13C]

13C

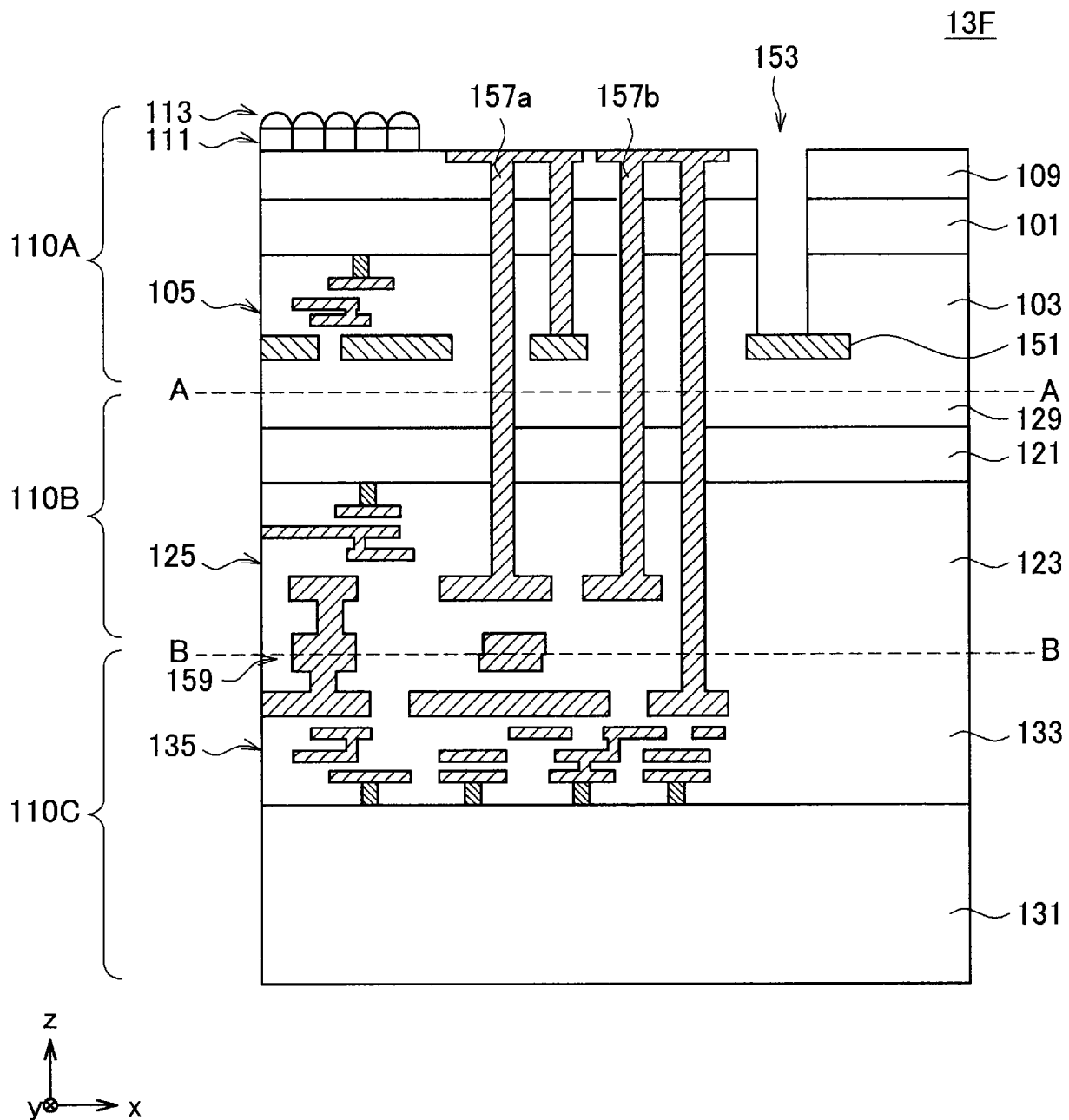
[図13D]



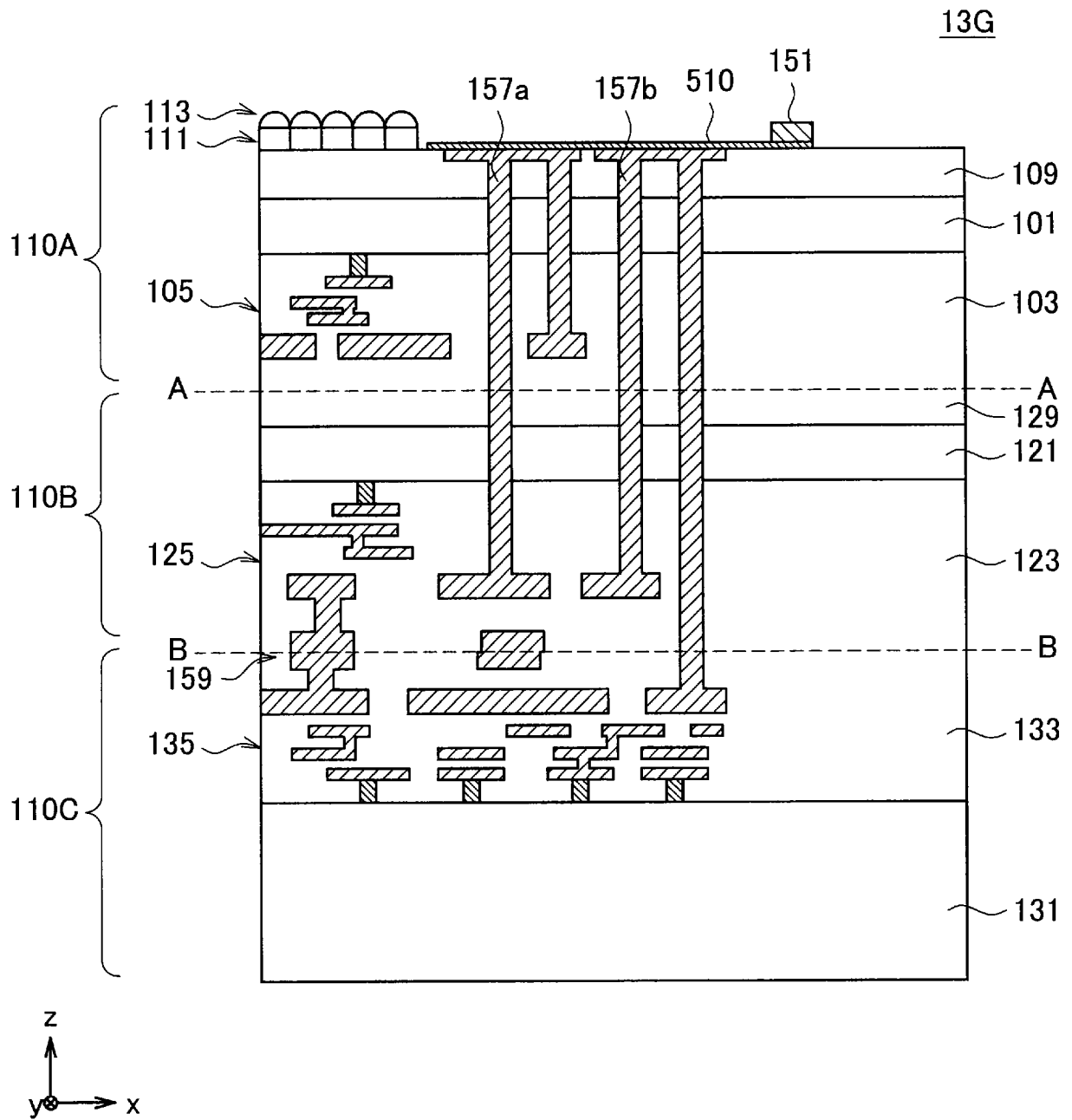
[図13E]



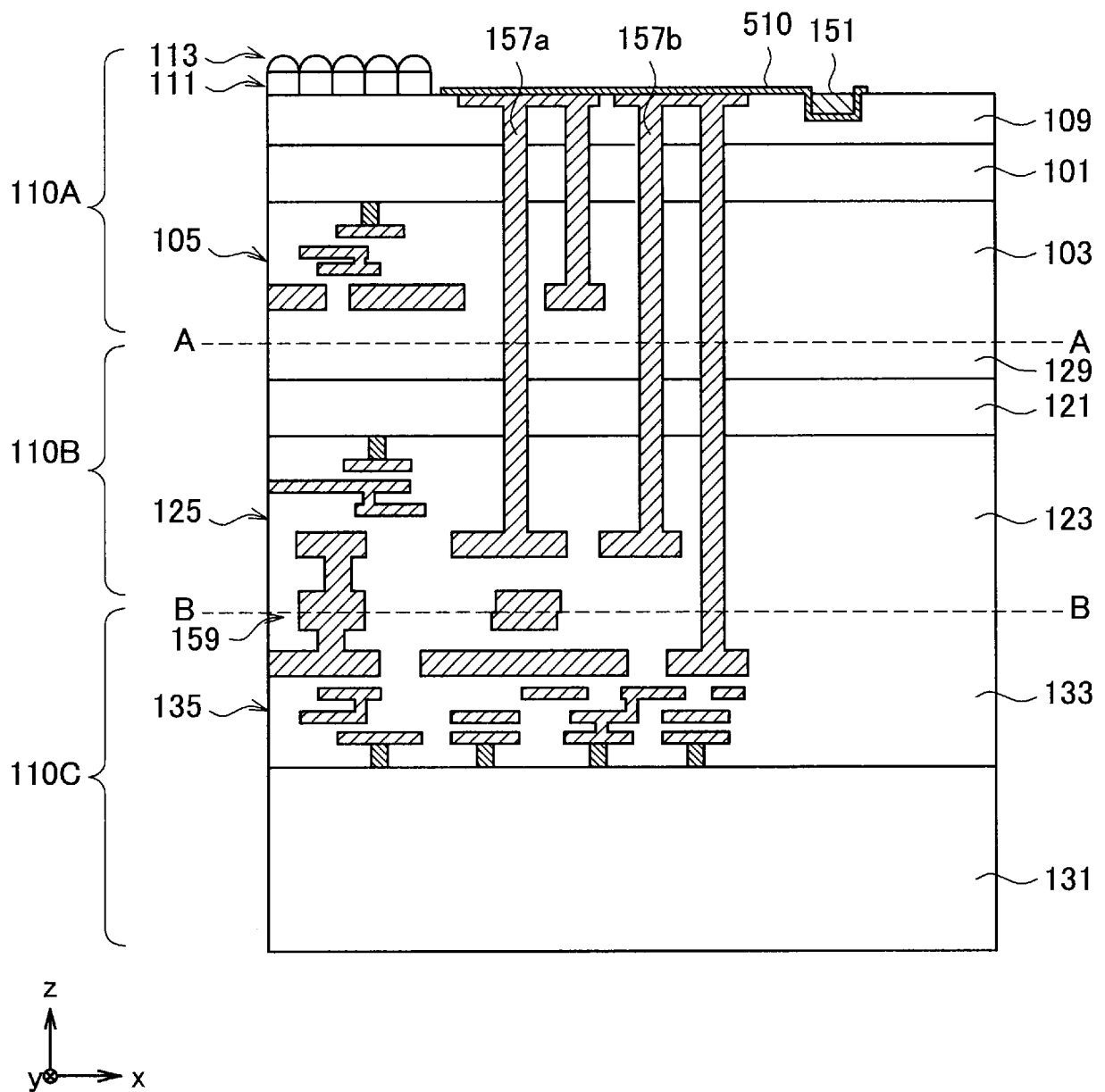
[図13F]



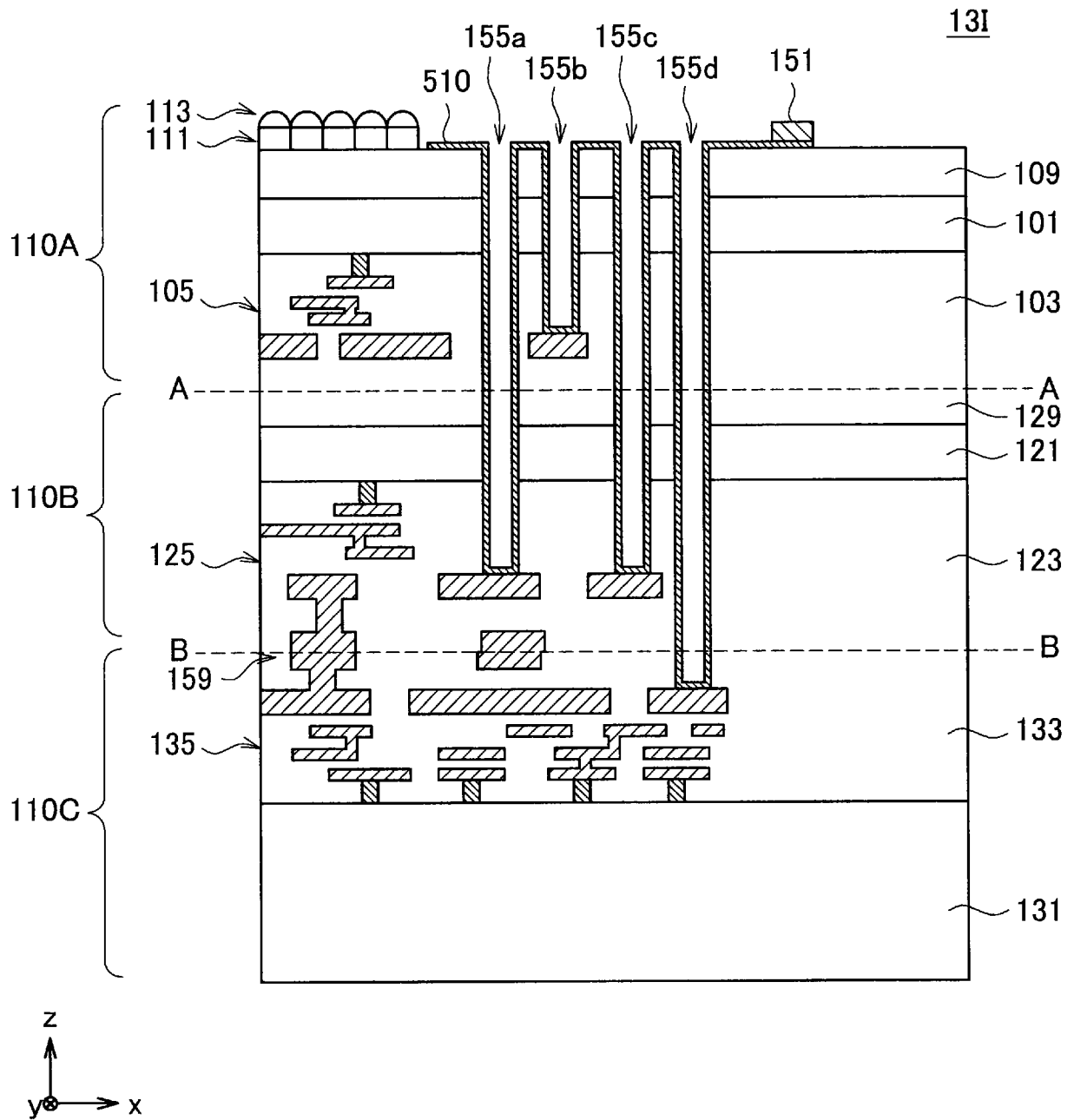
[図13G]



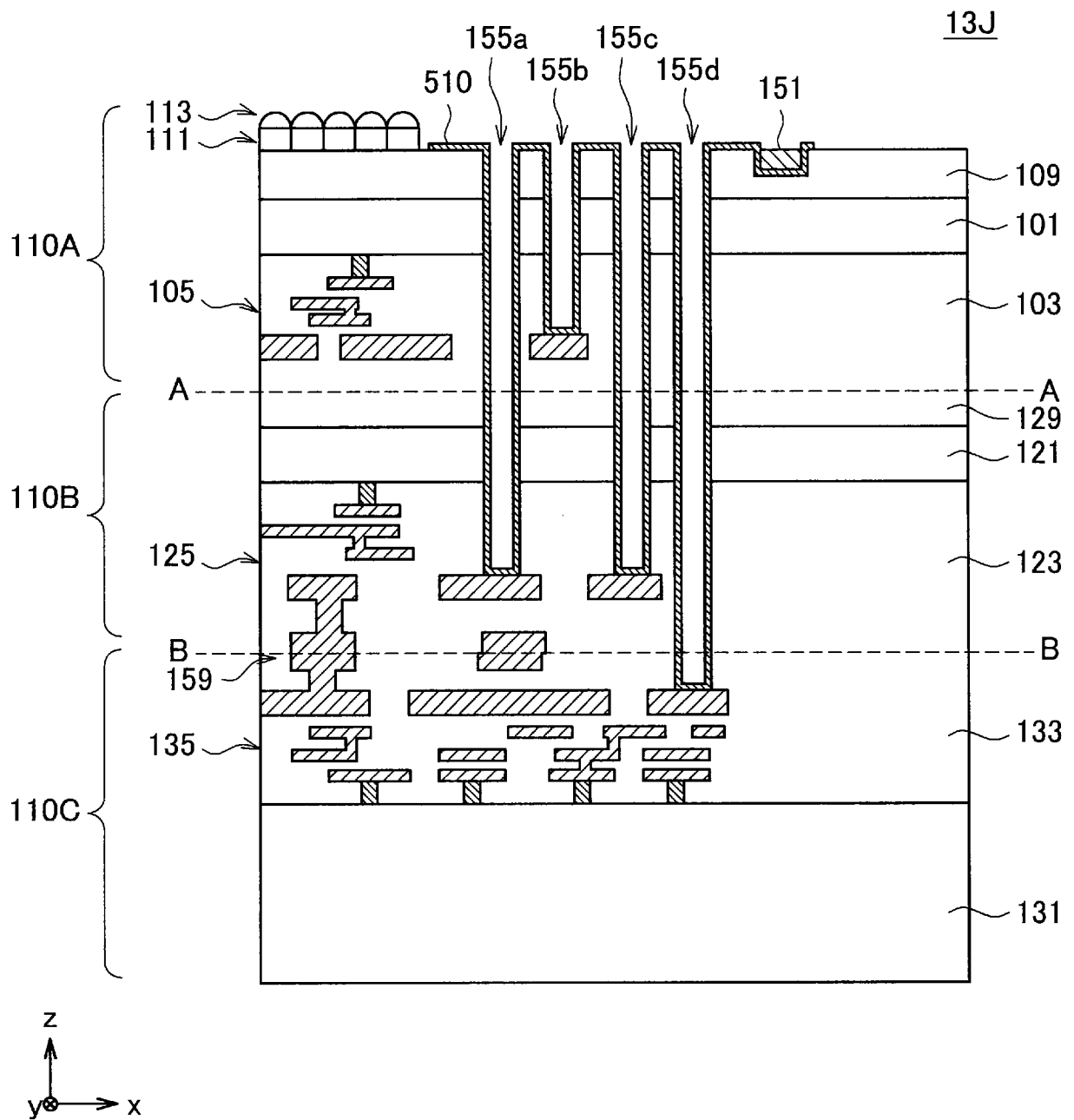
[図13H]

13H

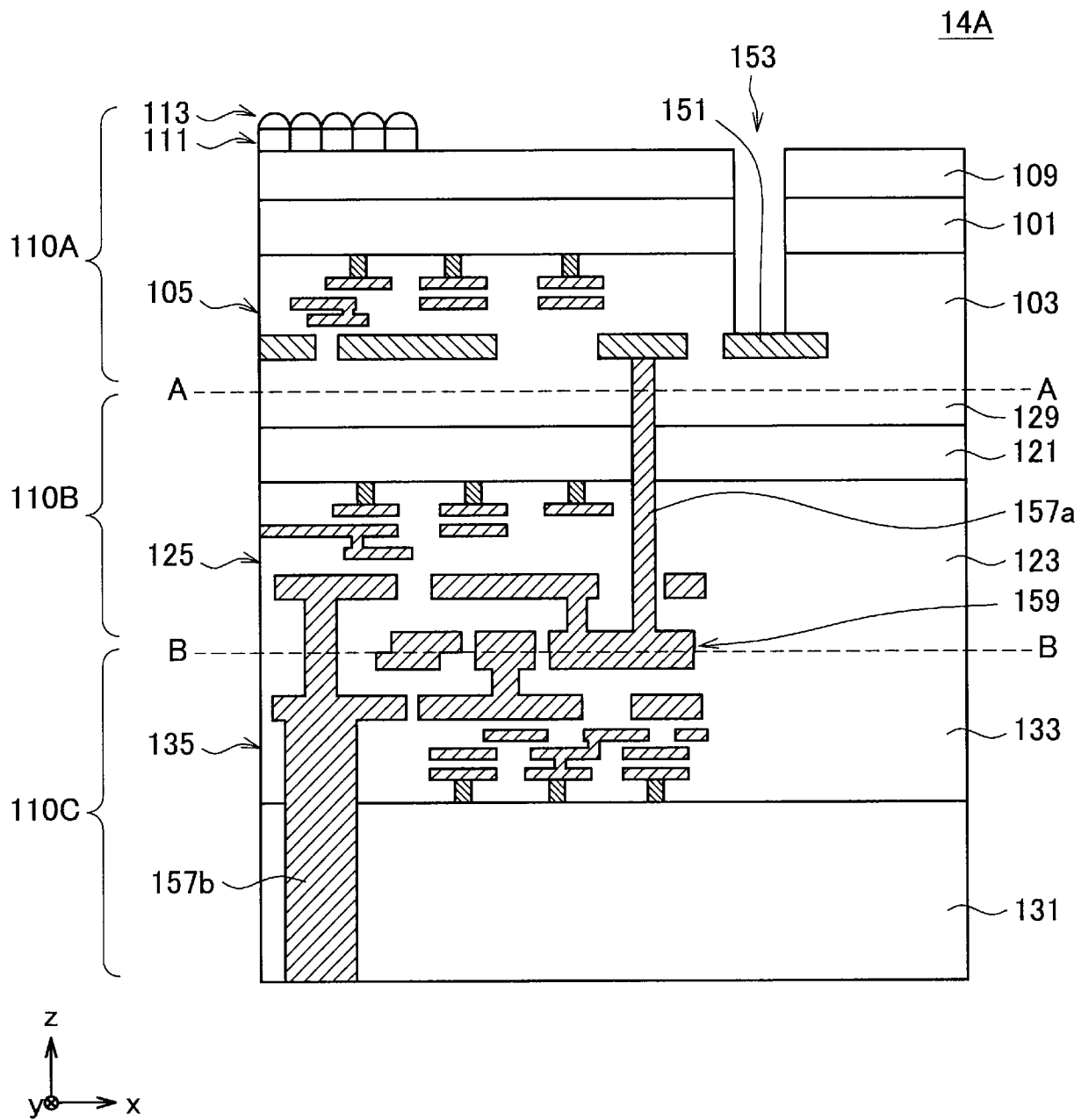
[図13I]



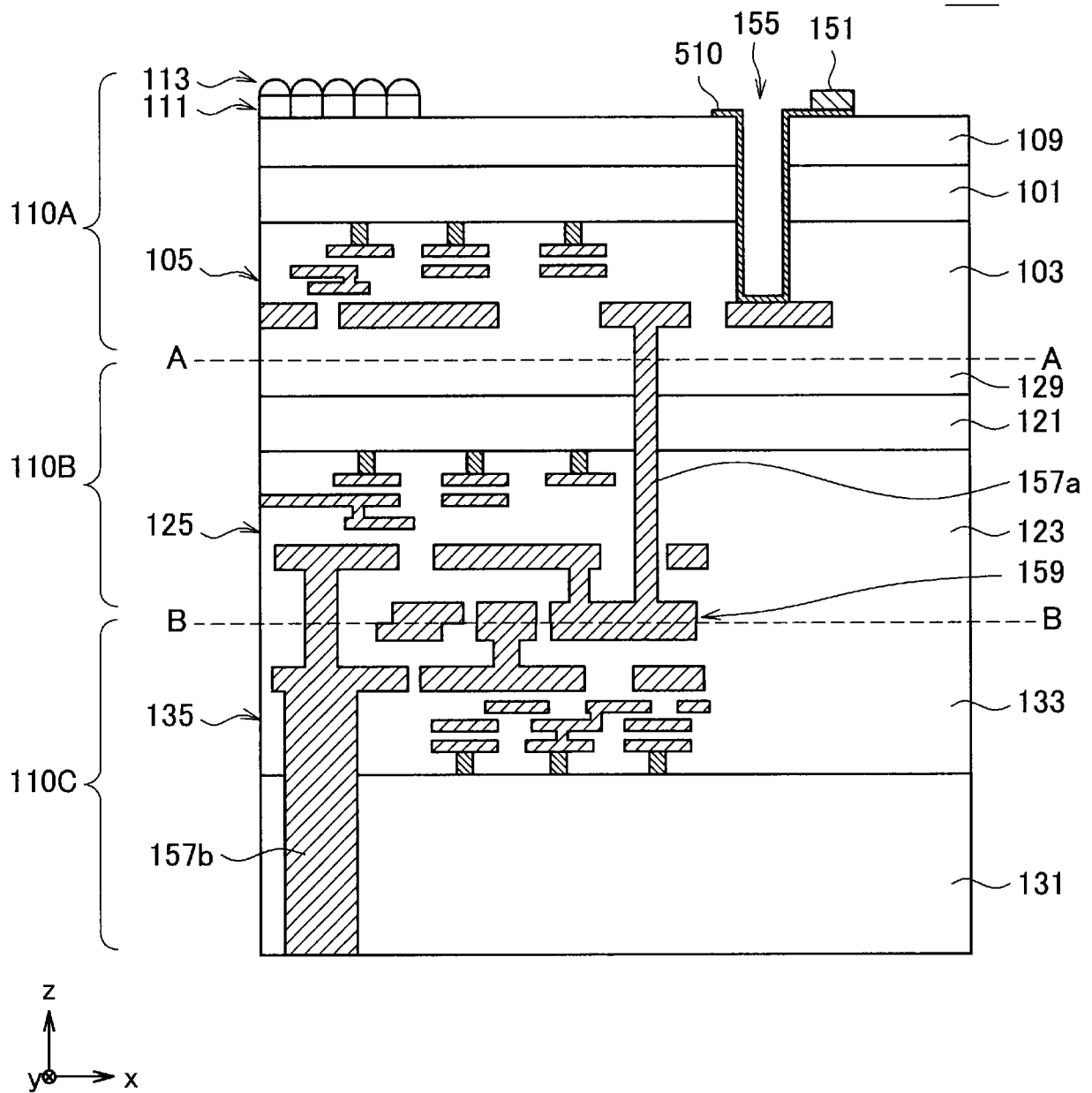
[図13J]



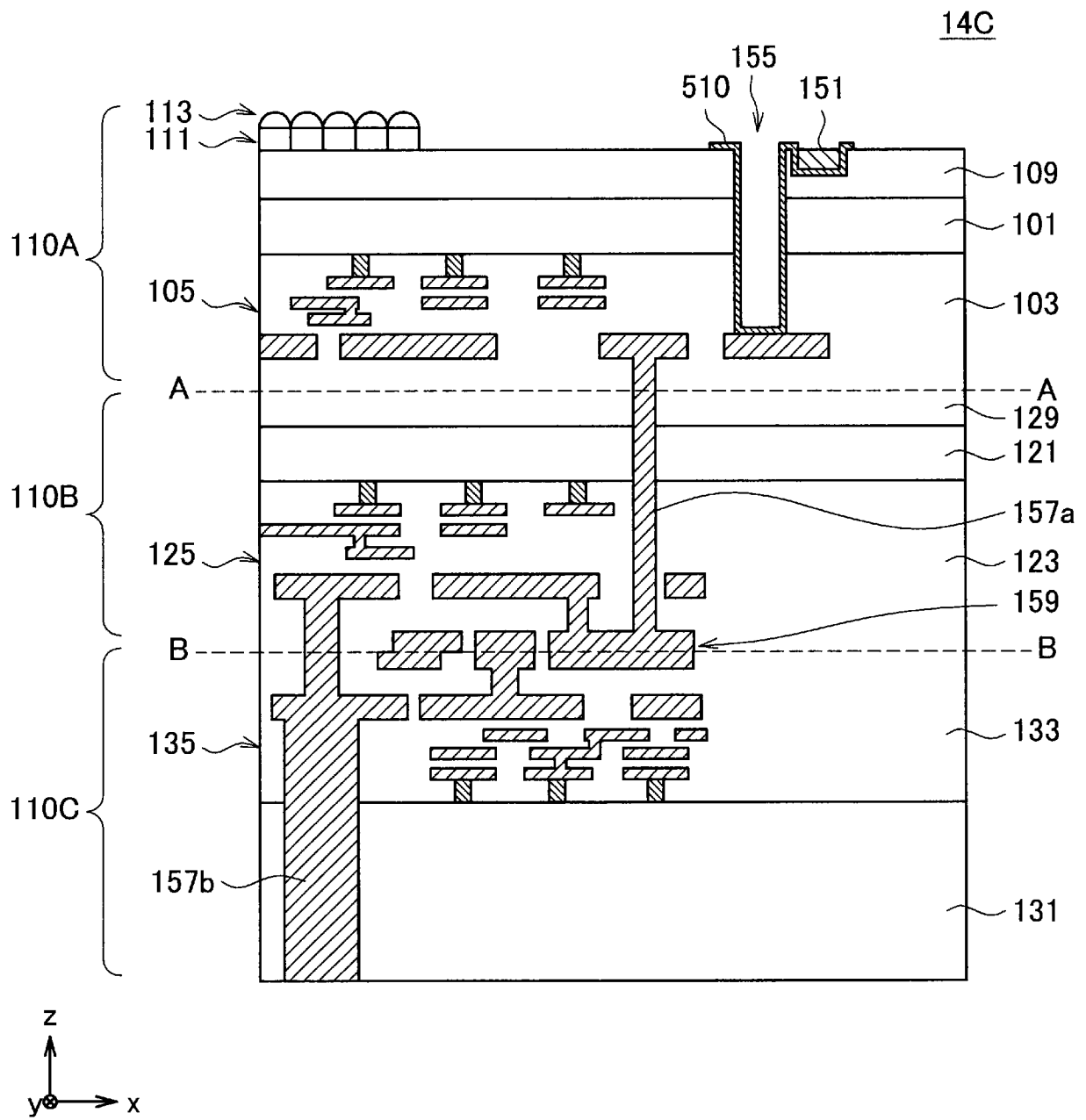
[図14A]



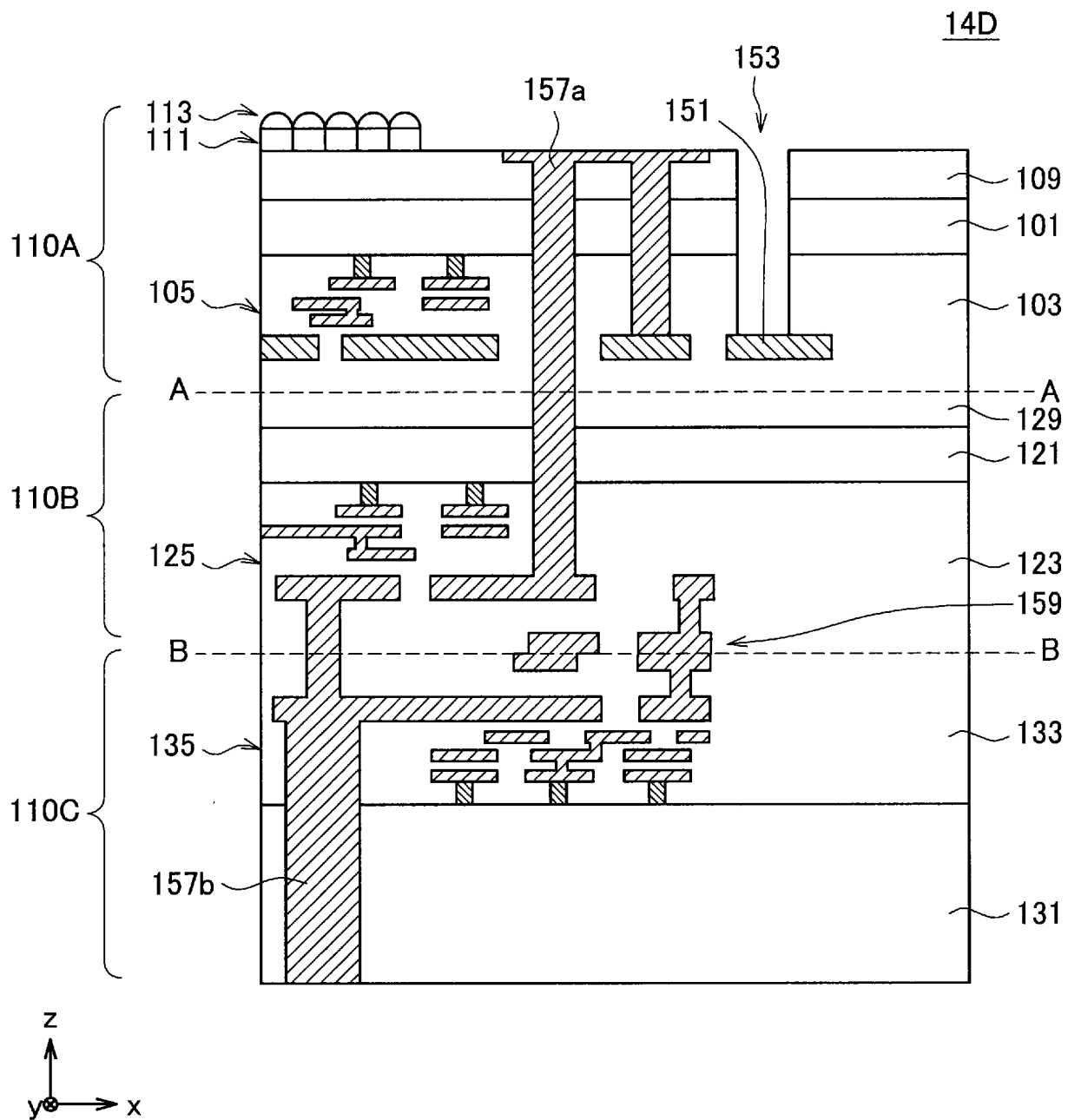
14B



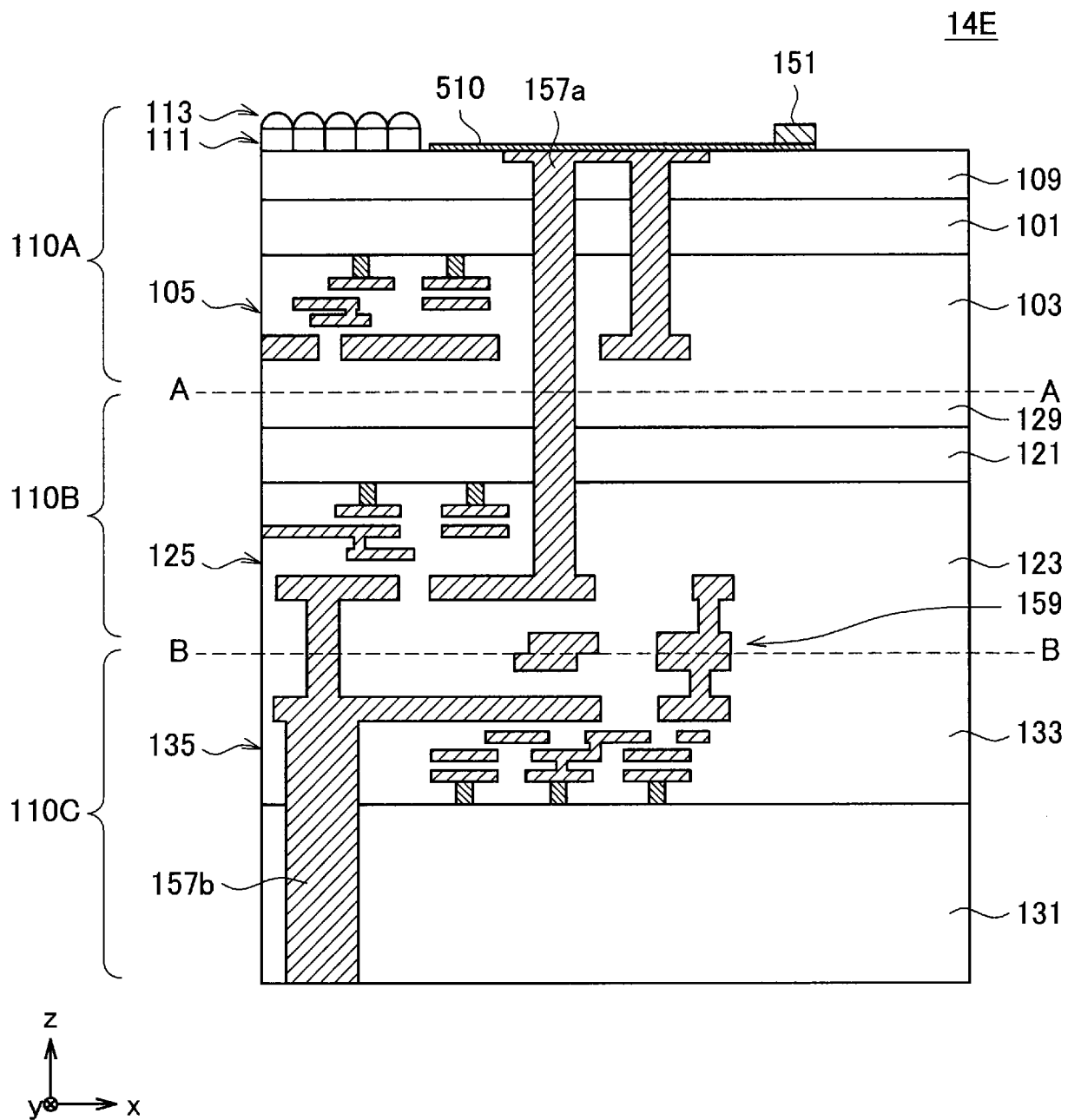
[図14C]



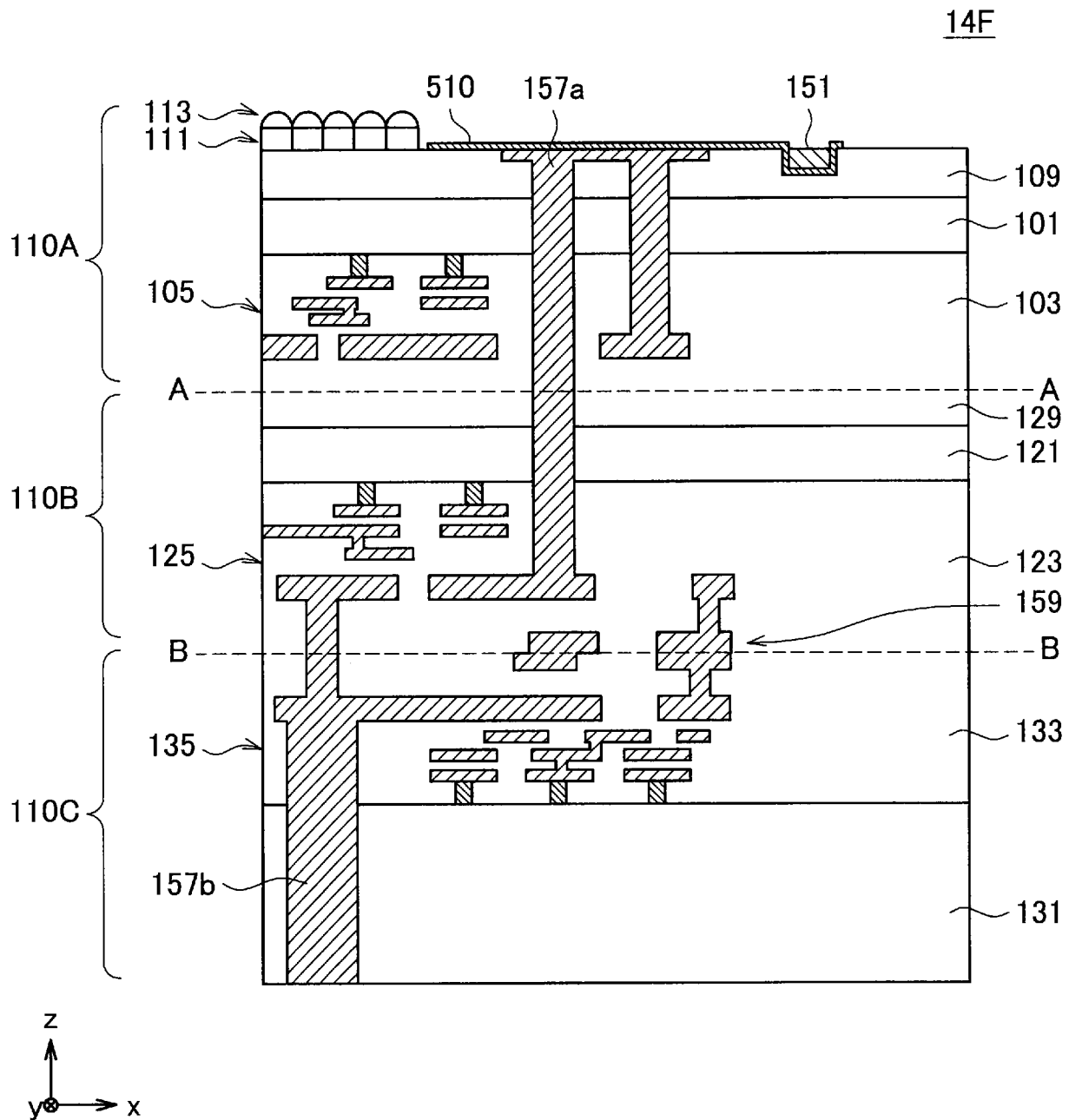
[図14D]



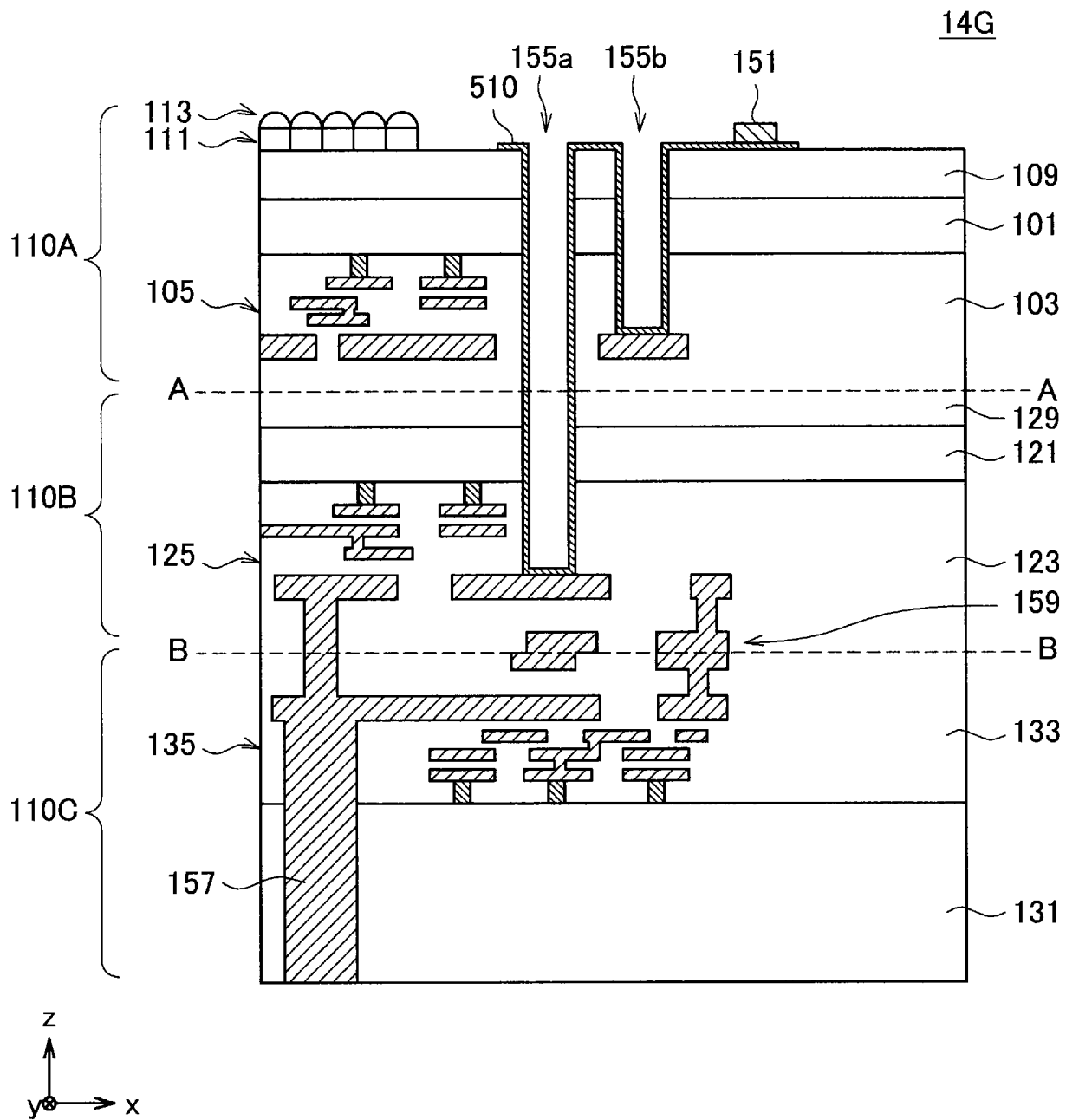
[図14E]



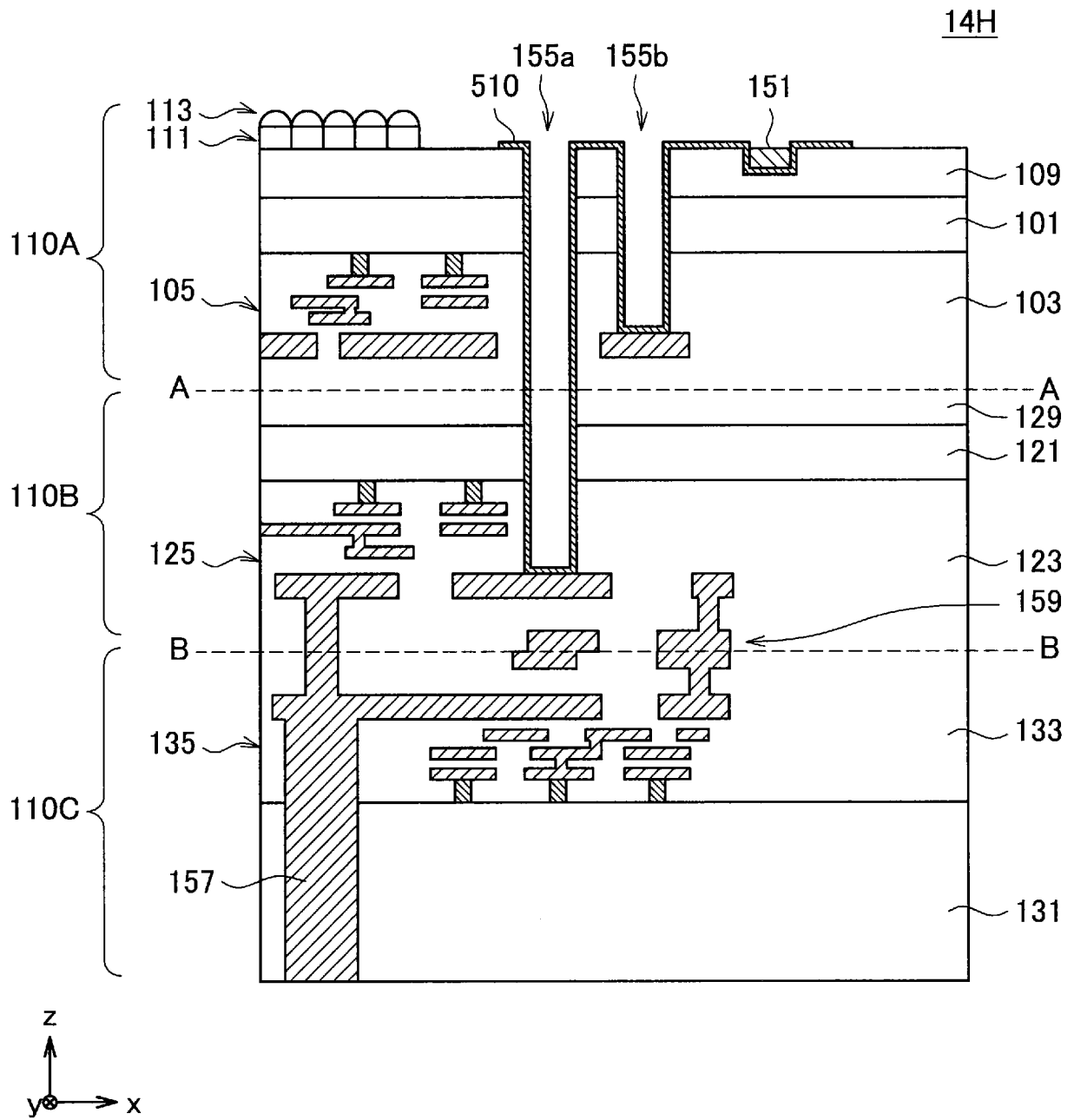
[図14F]



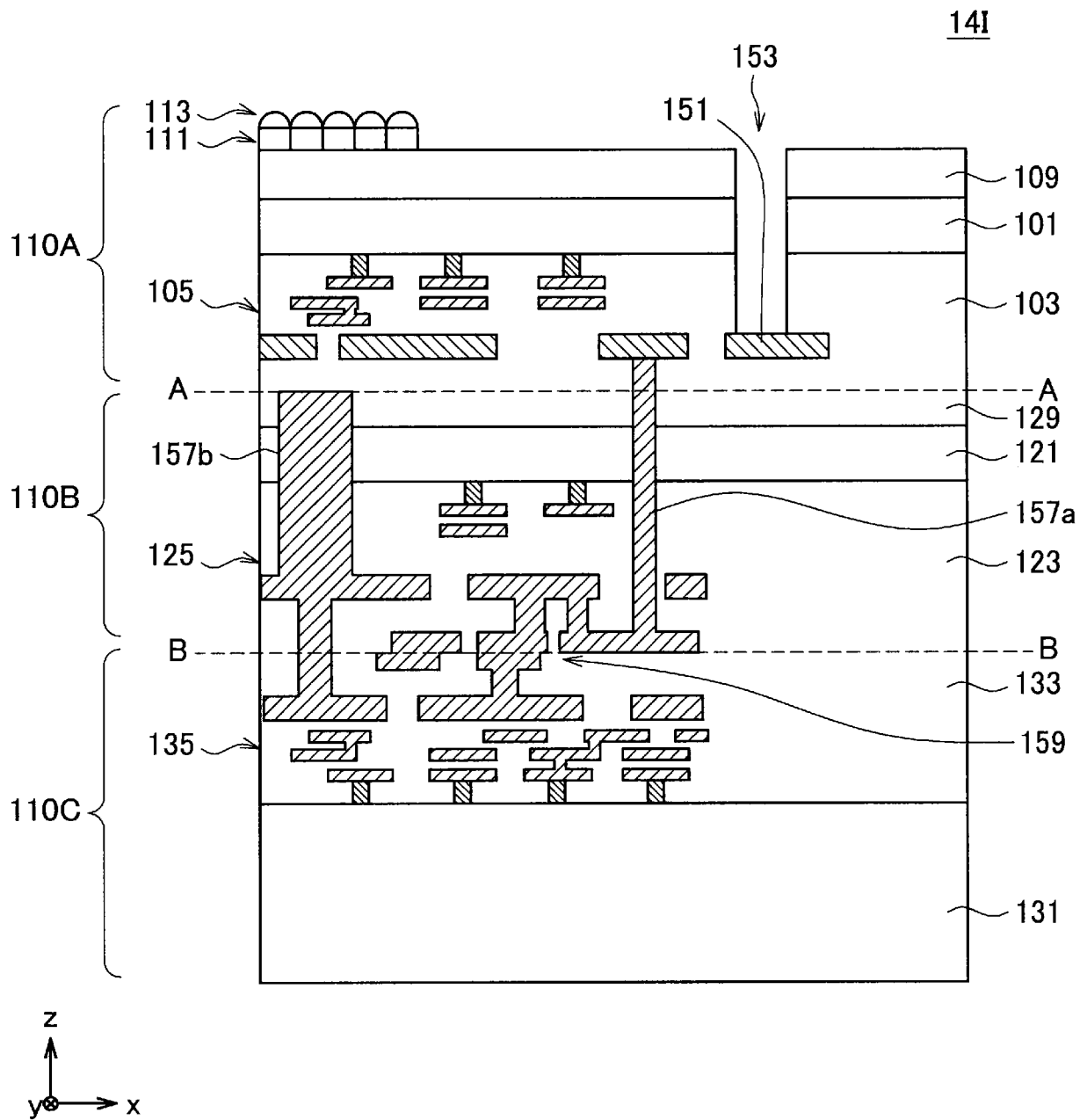
[図14G]



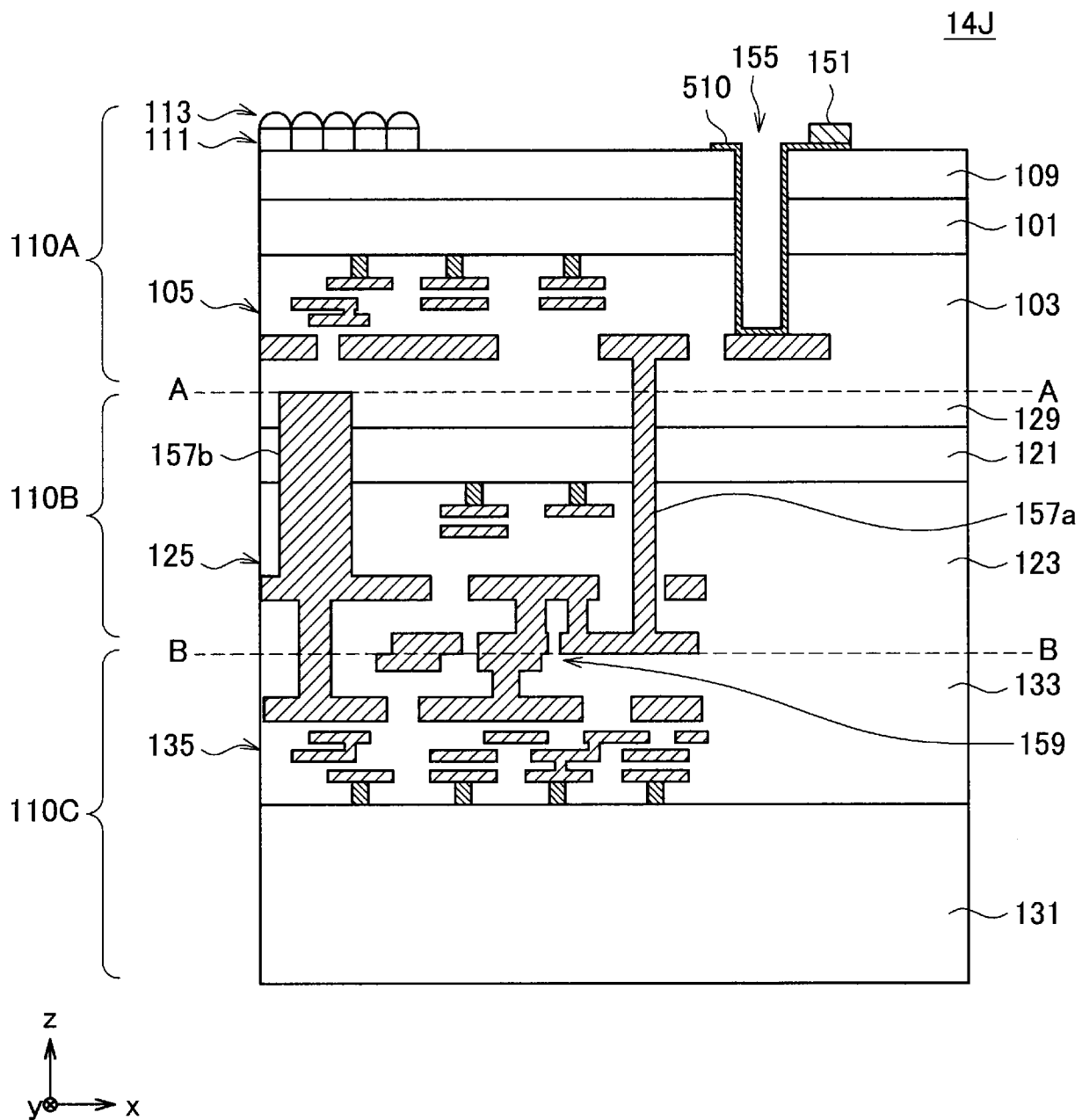
[図14H]



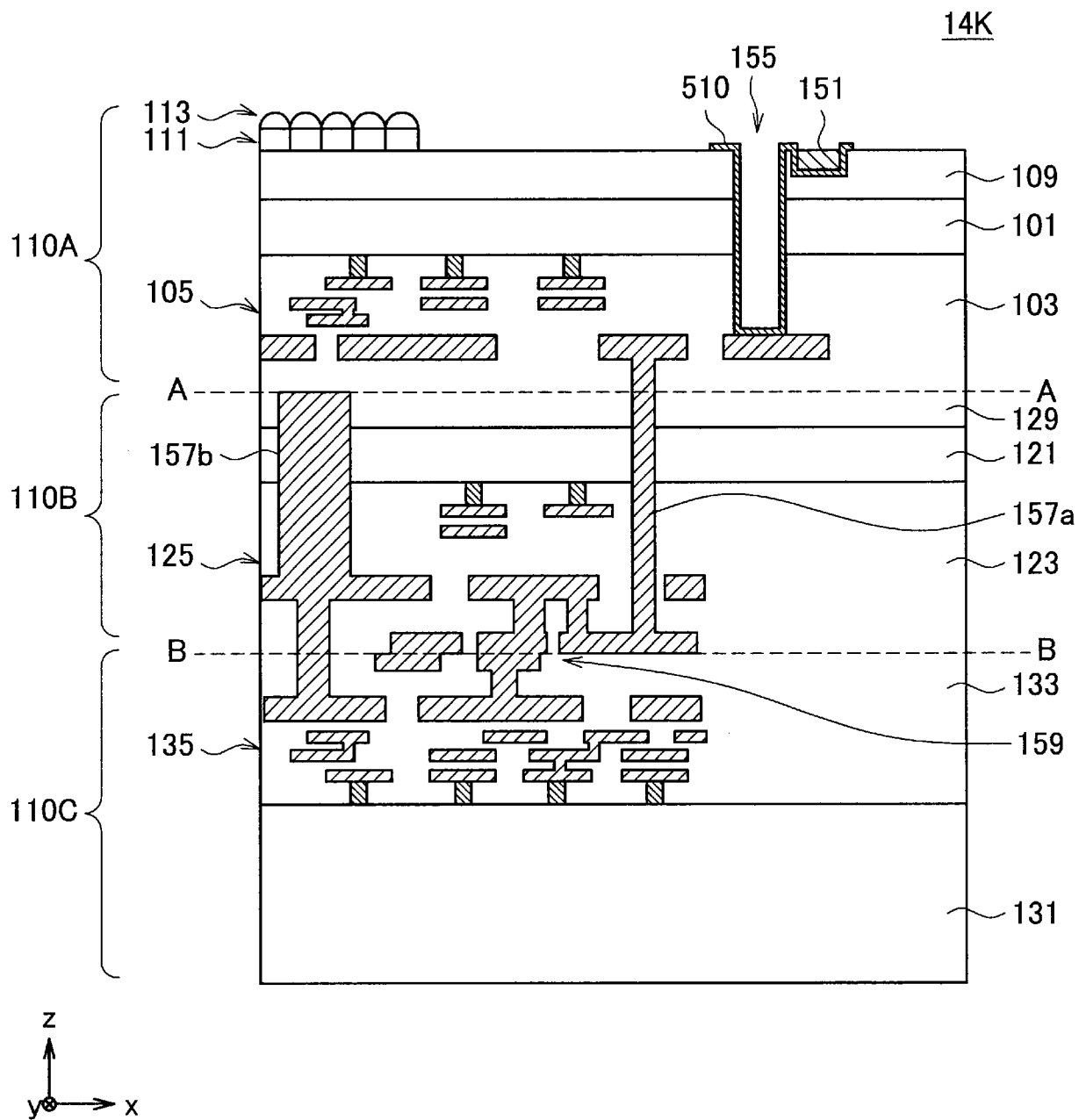
[図14I]



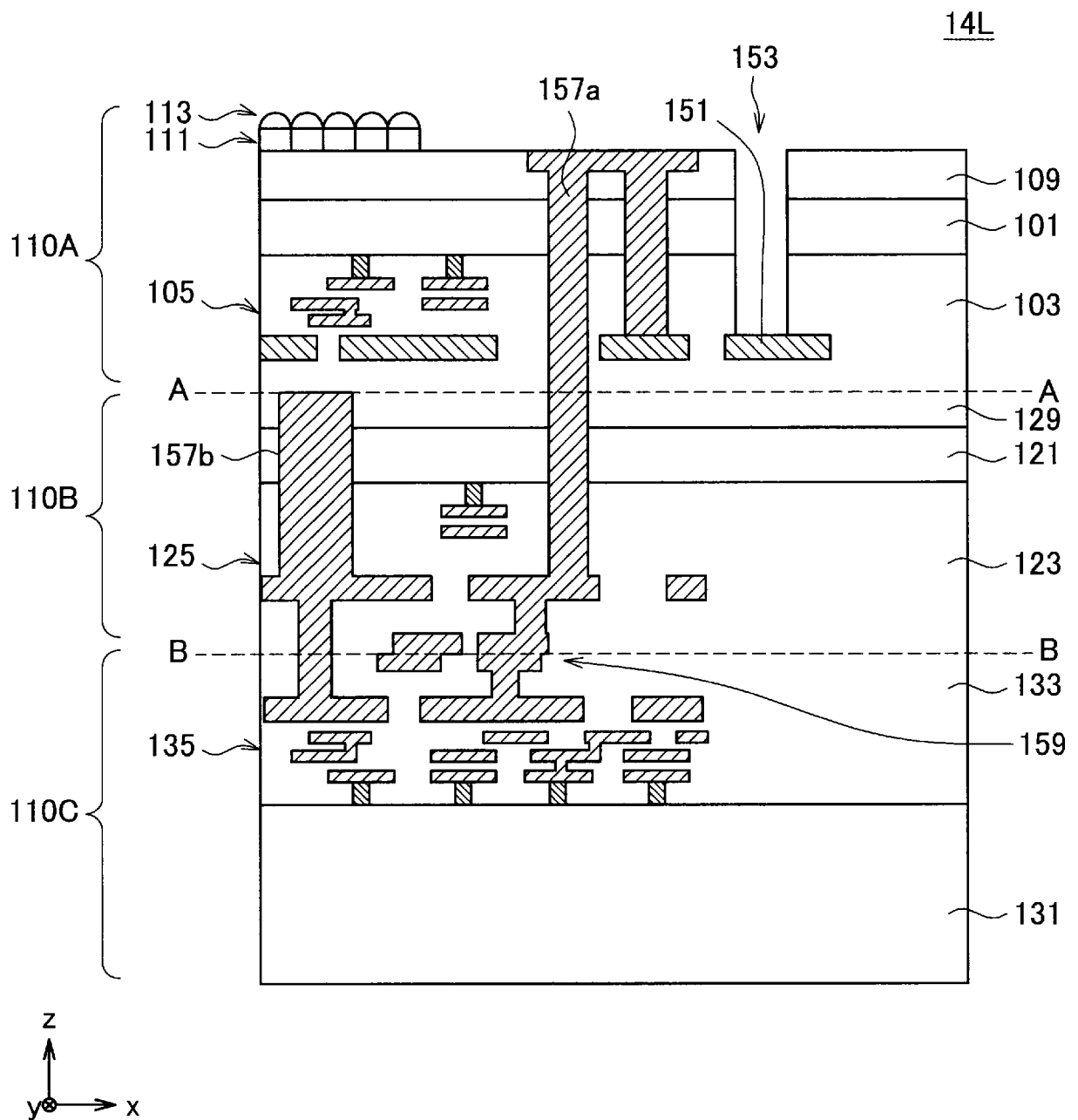
[図14J]



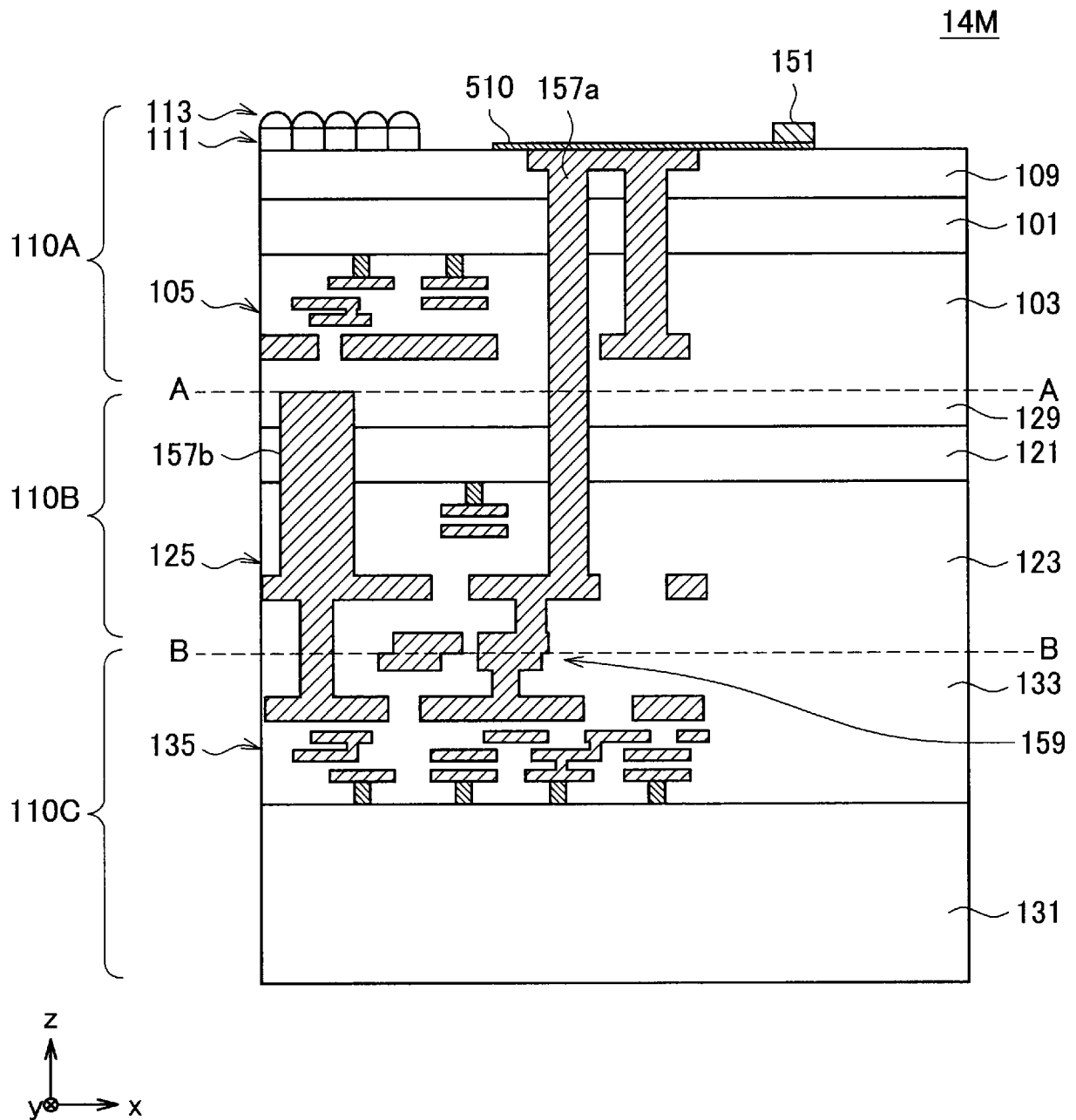
[図14K]



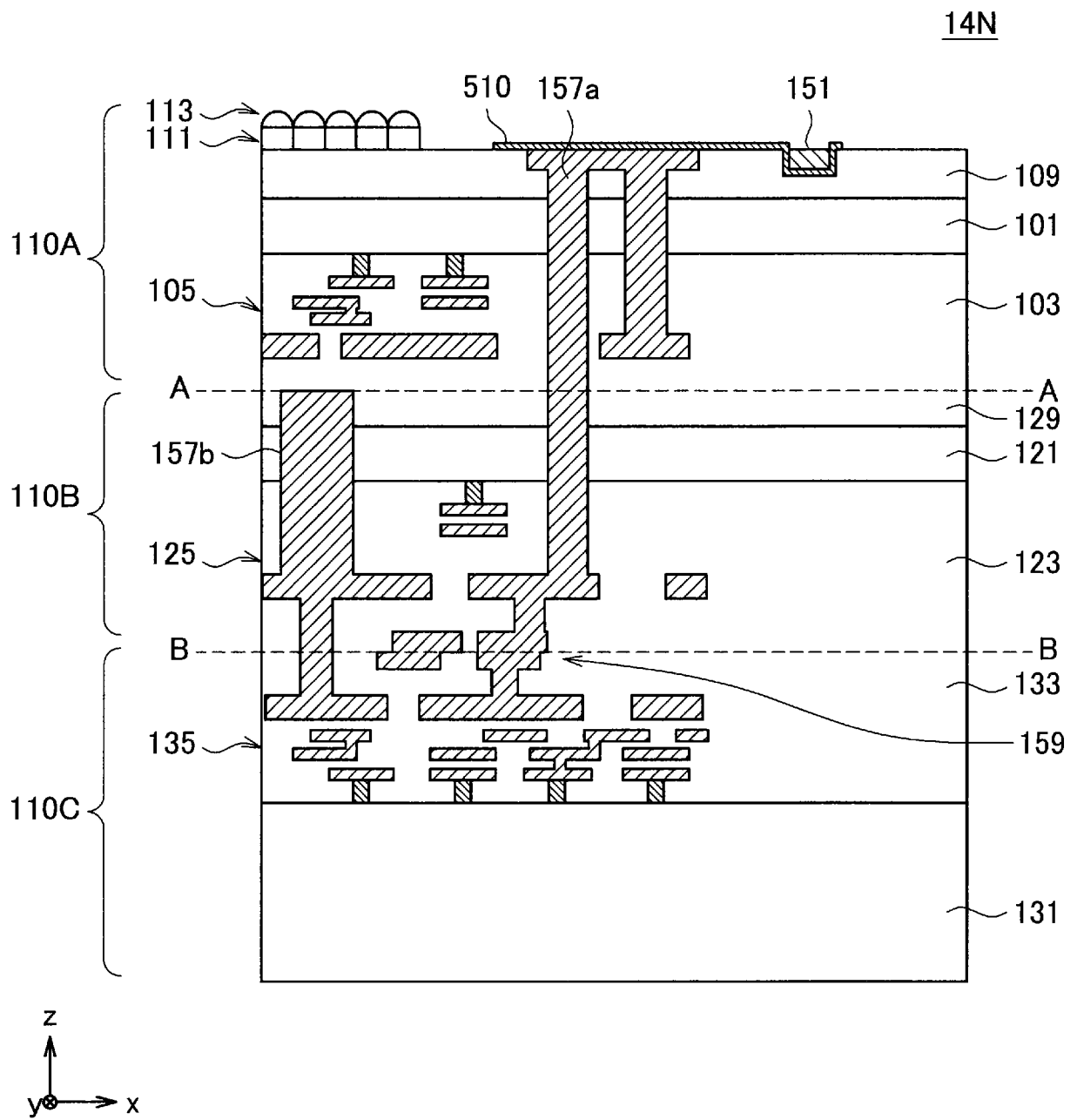
[図14L]



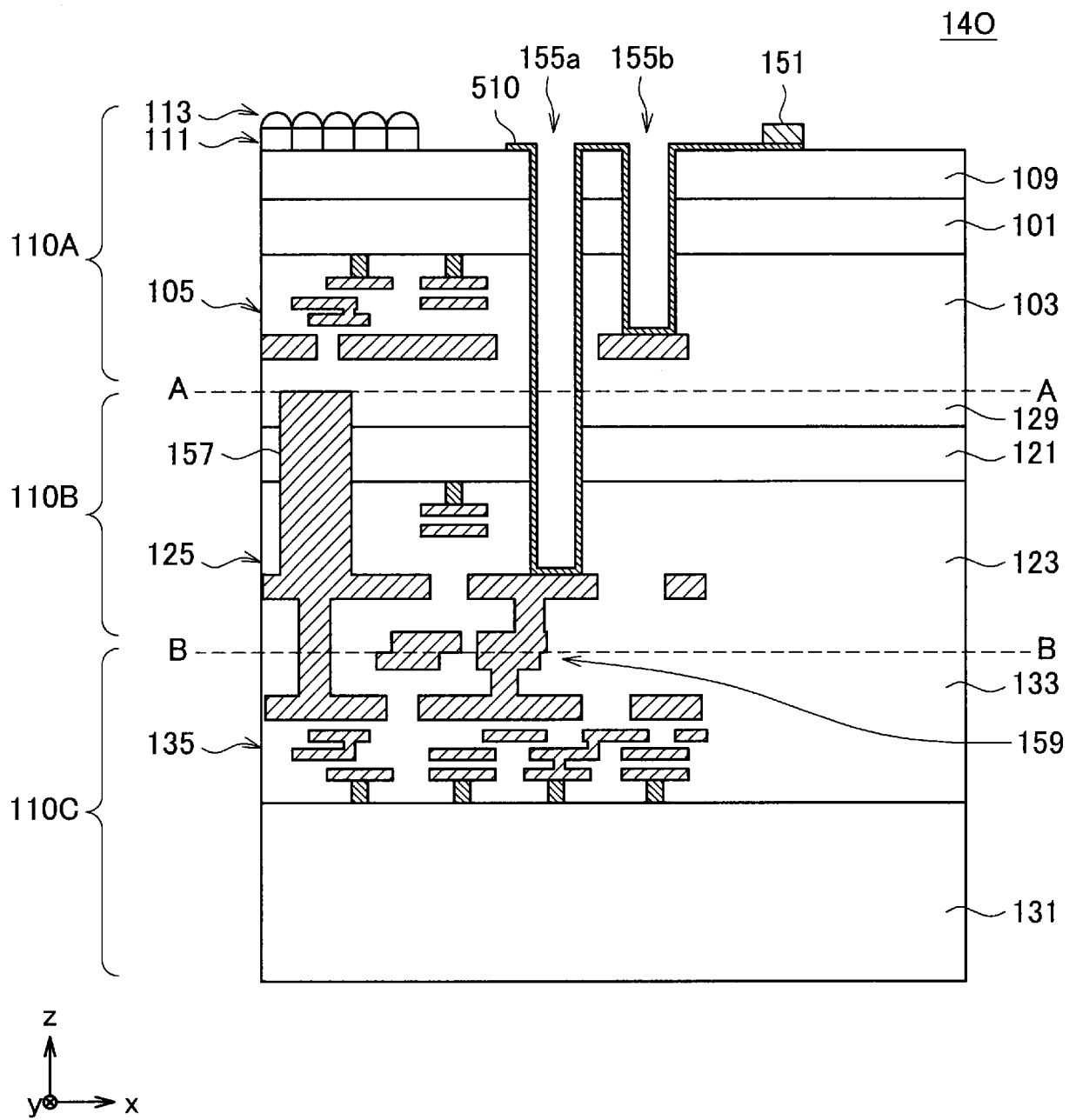
[図14M]



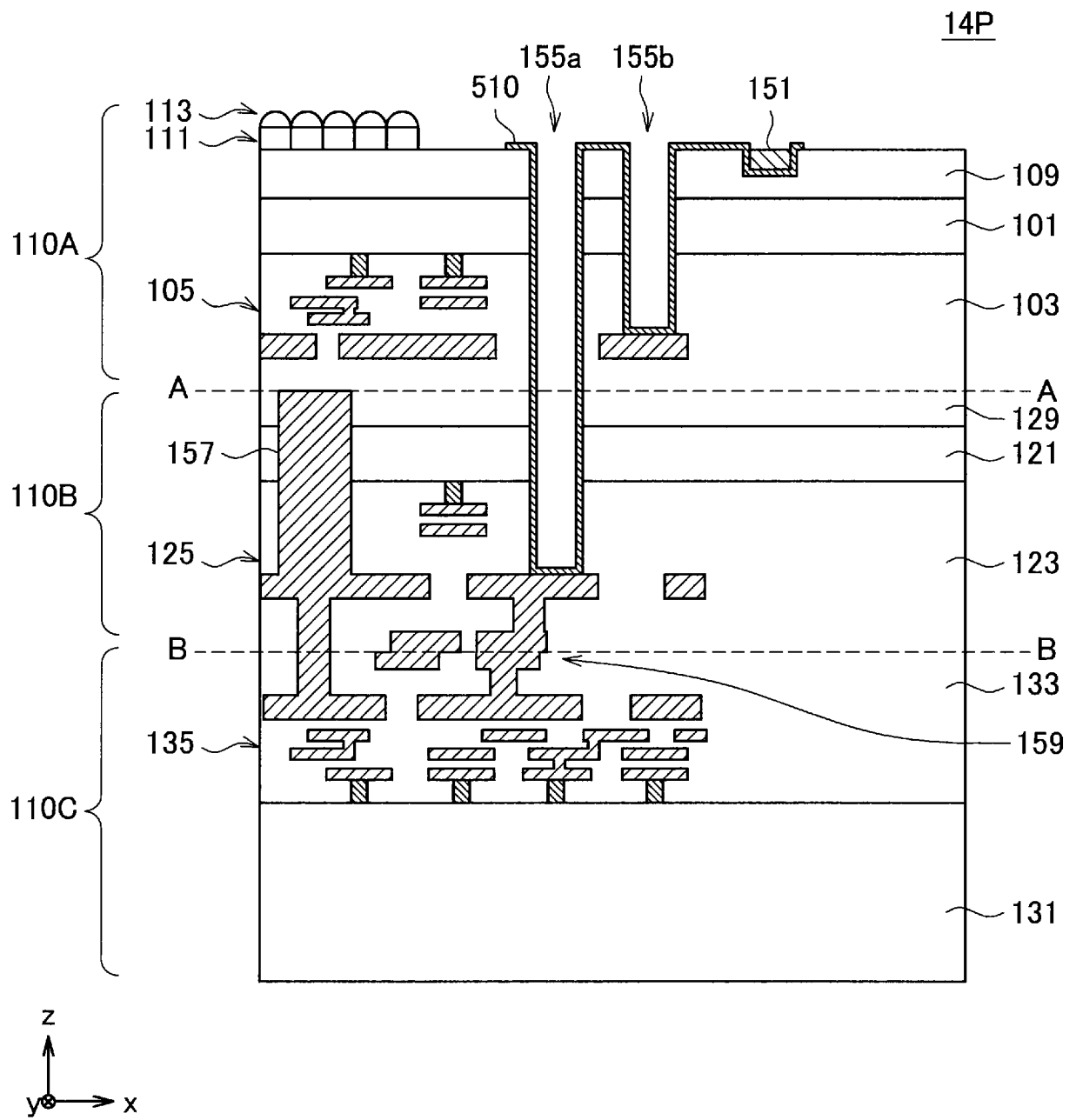
[図14N]



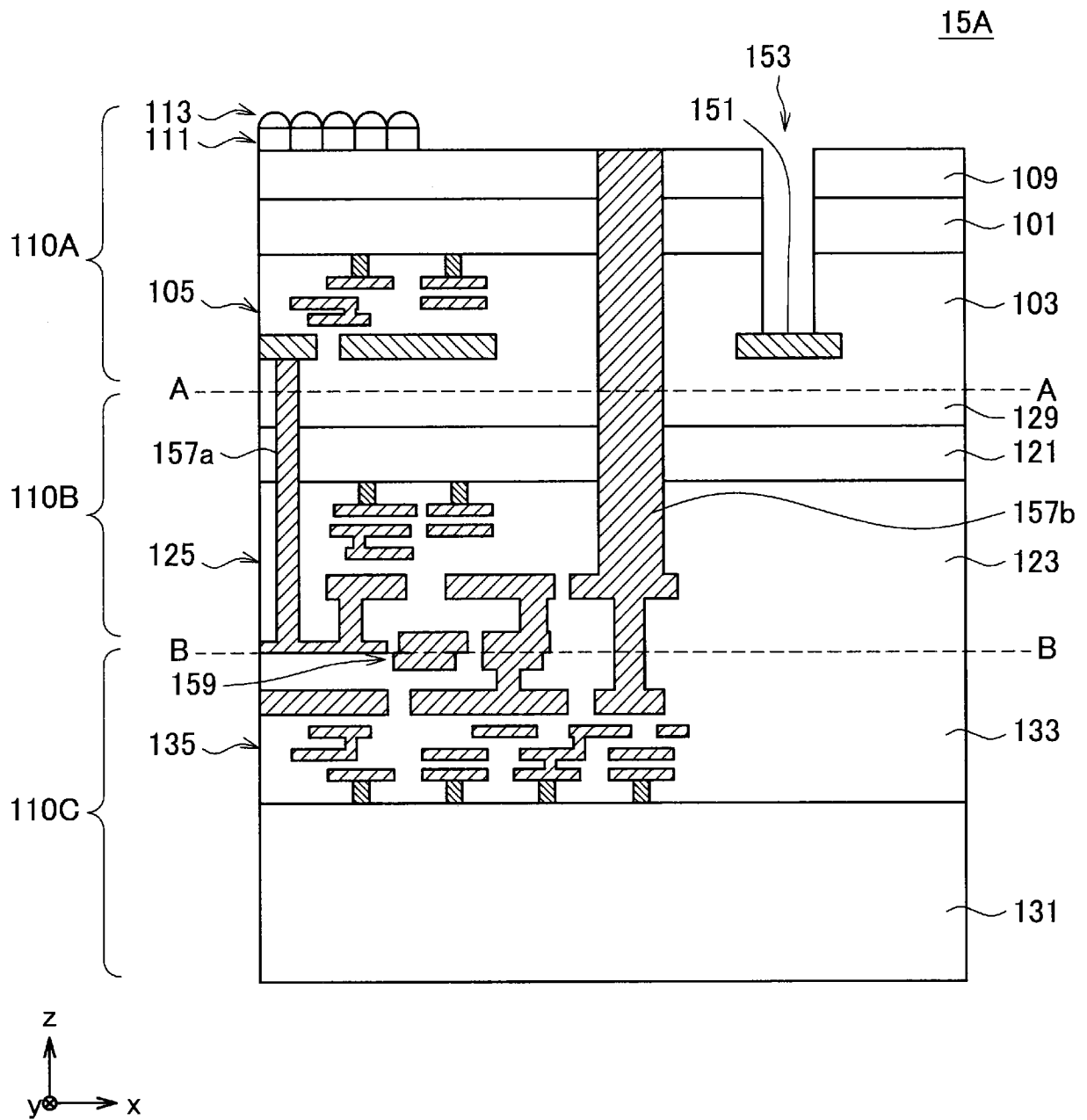
[図140]



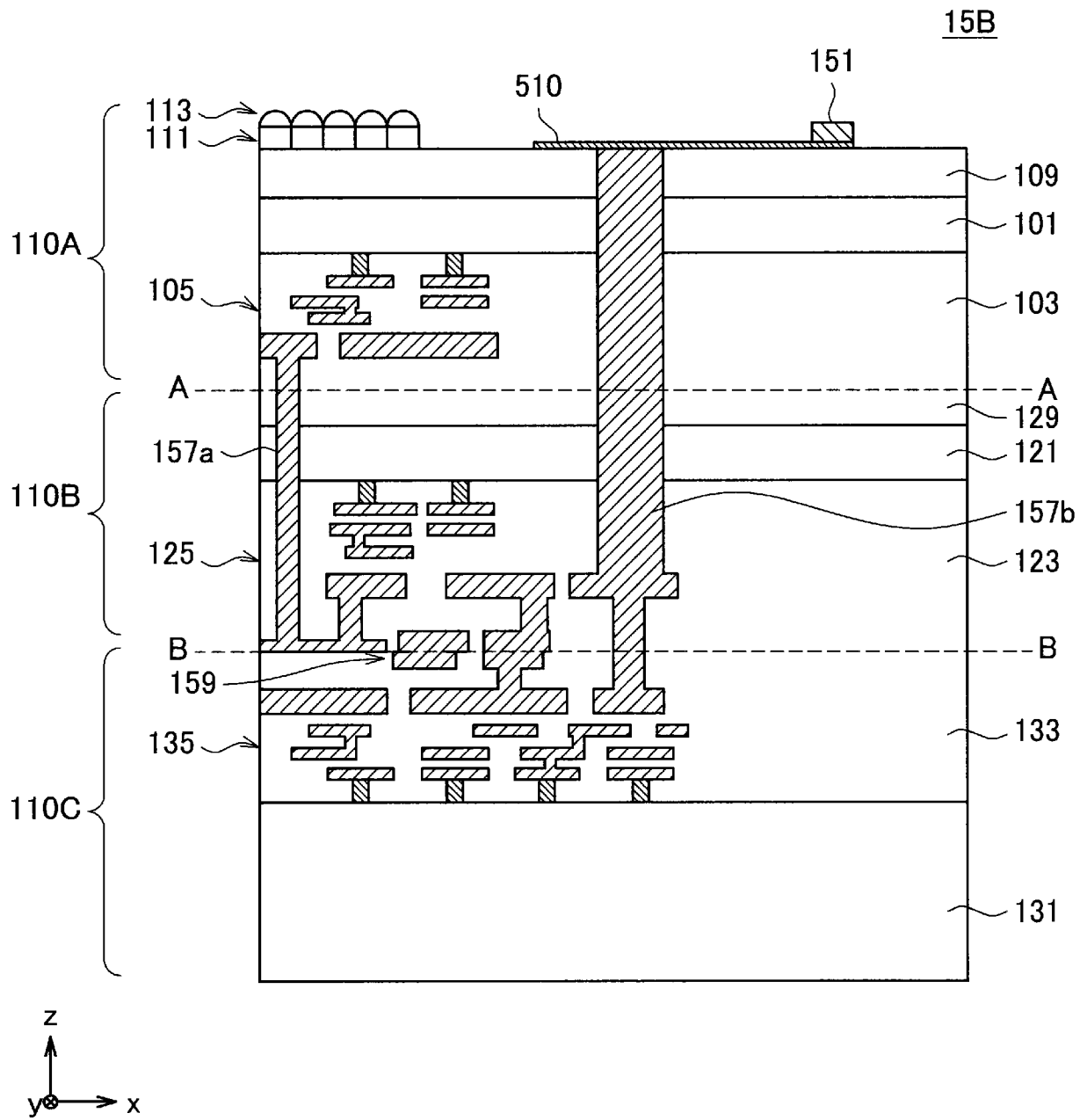
[図14P]



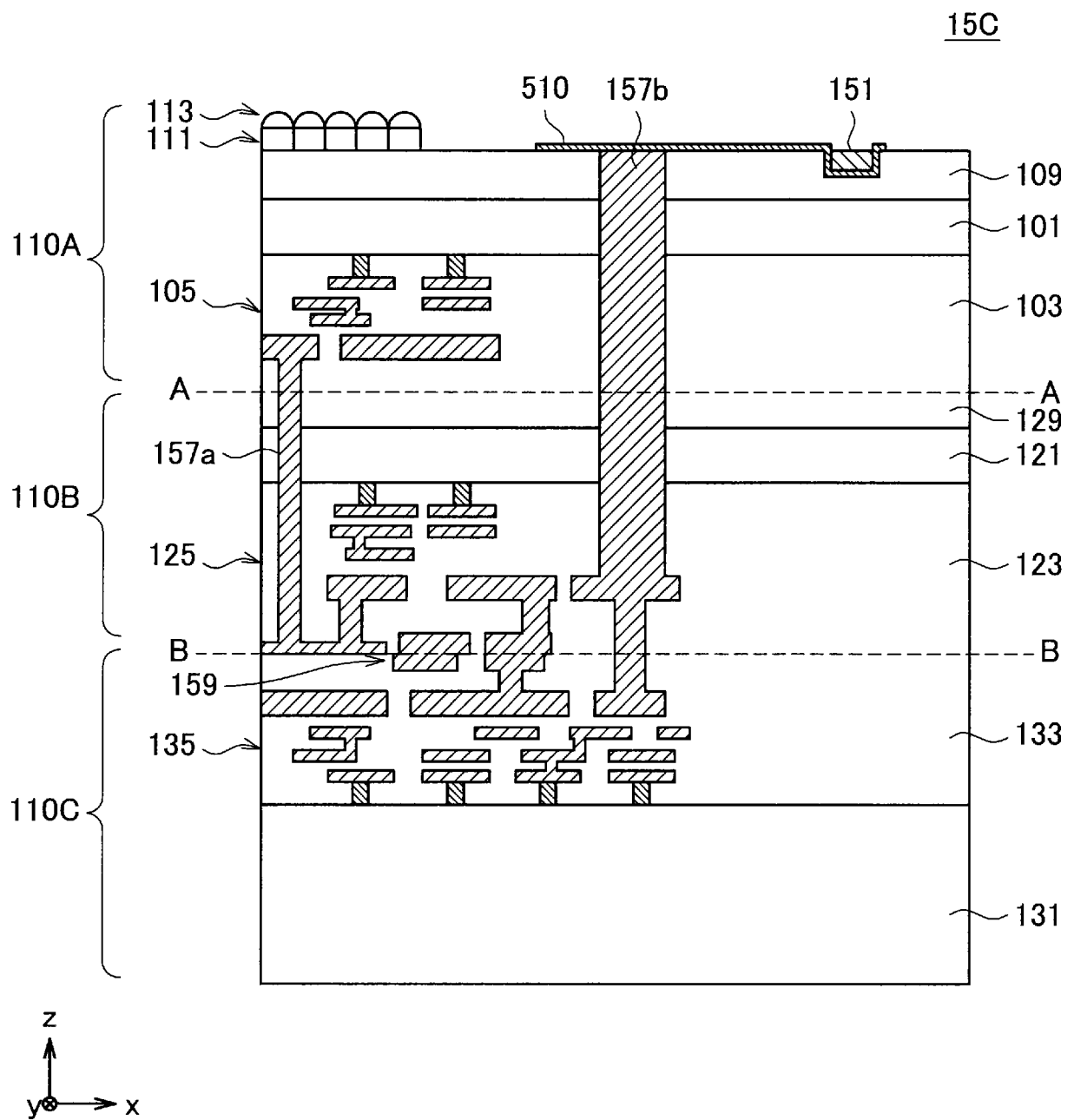
[図15A]



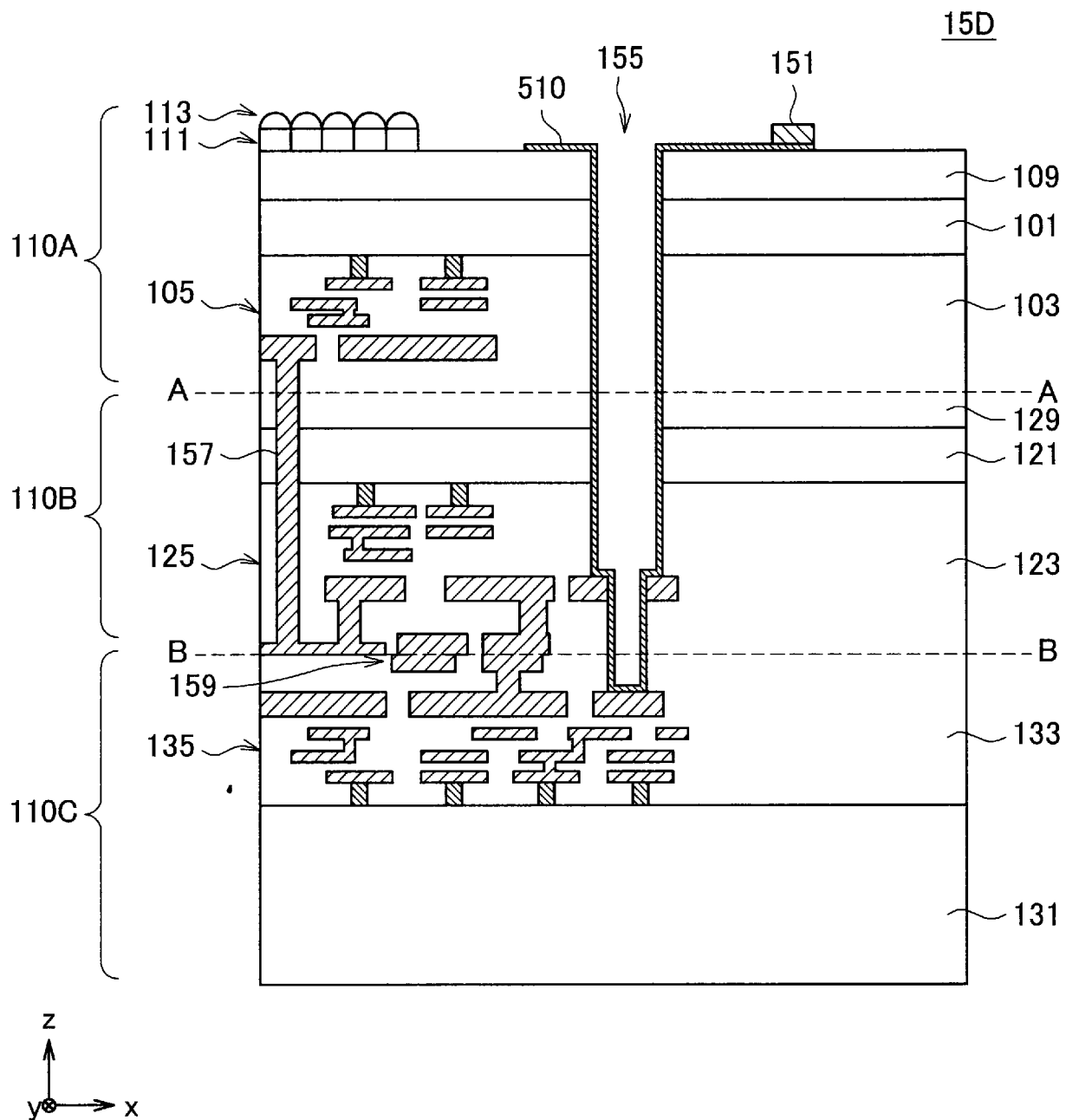
[図15B]



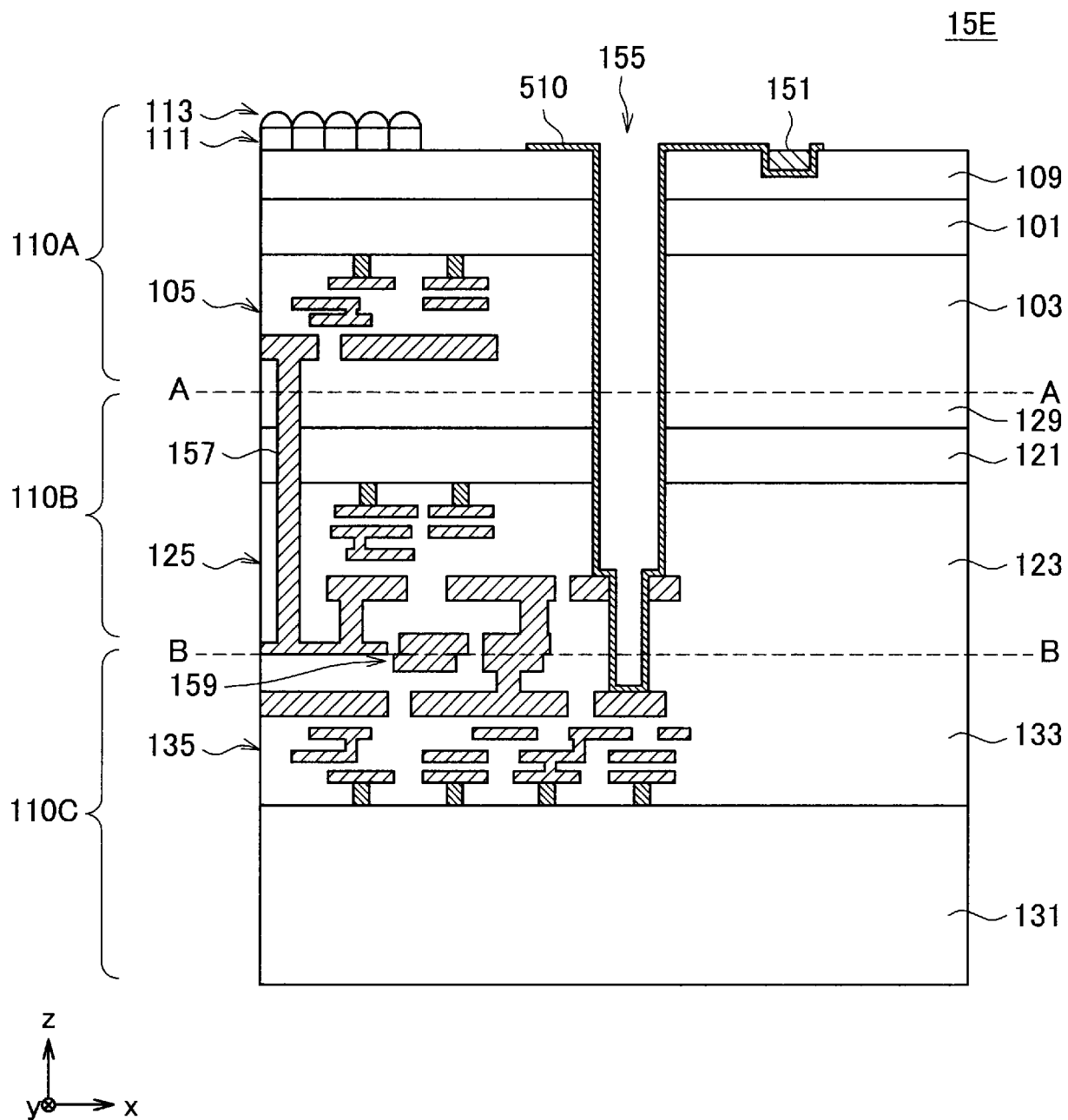
[図15C]



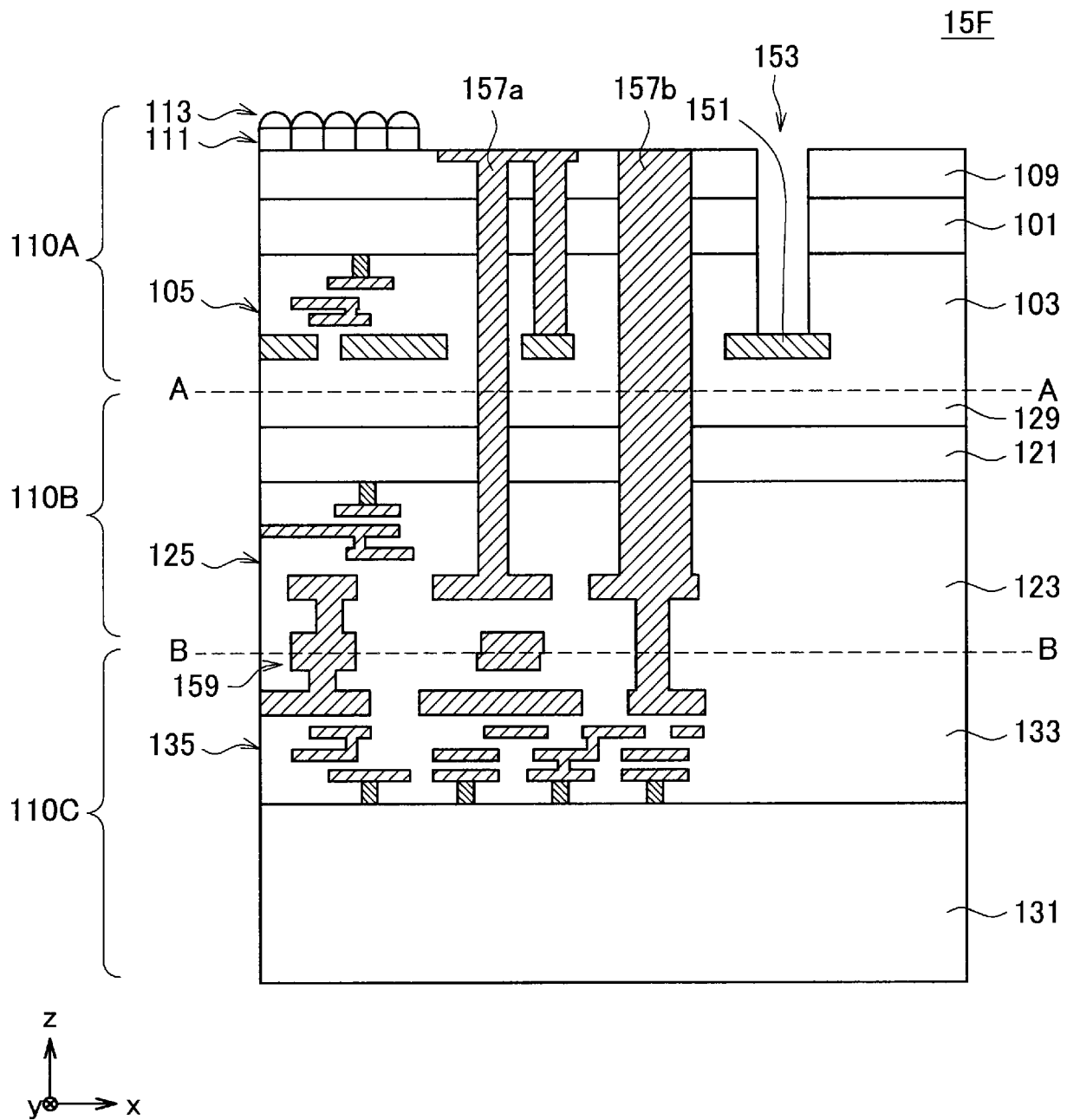
[図15D]



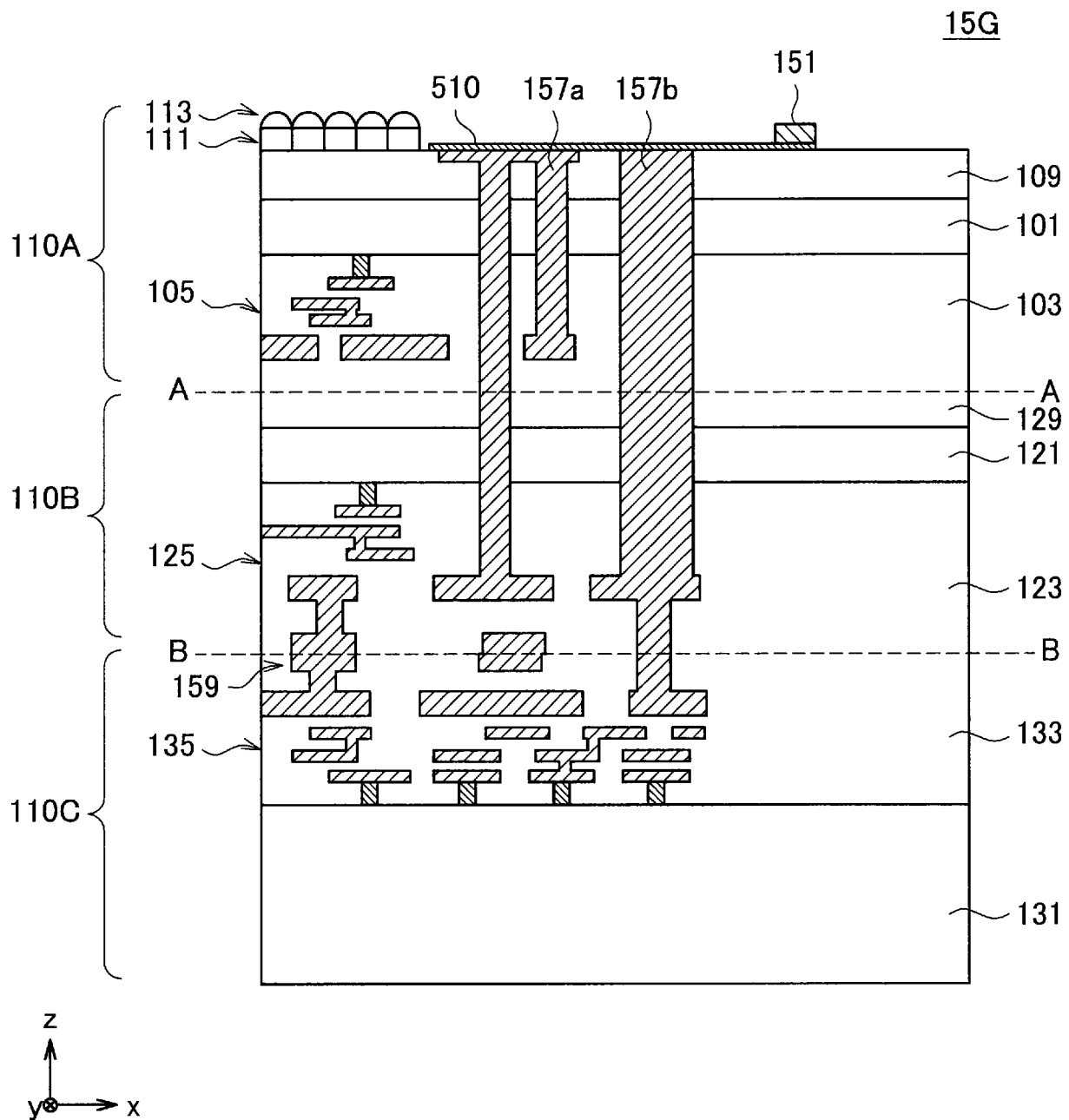
[図15E]



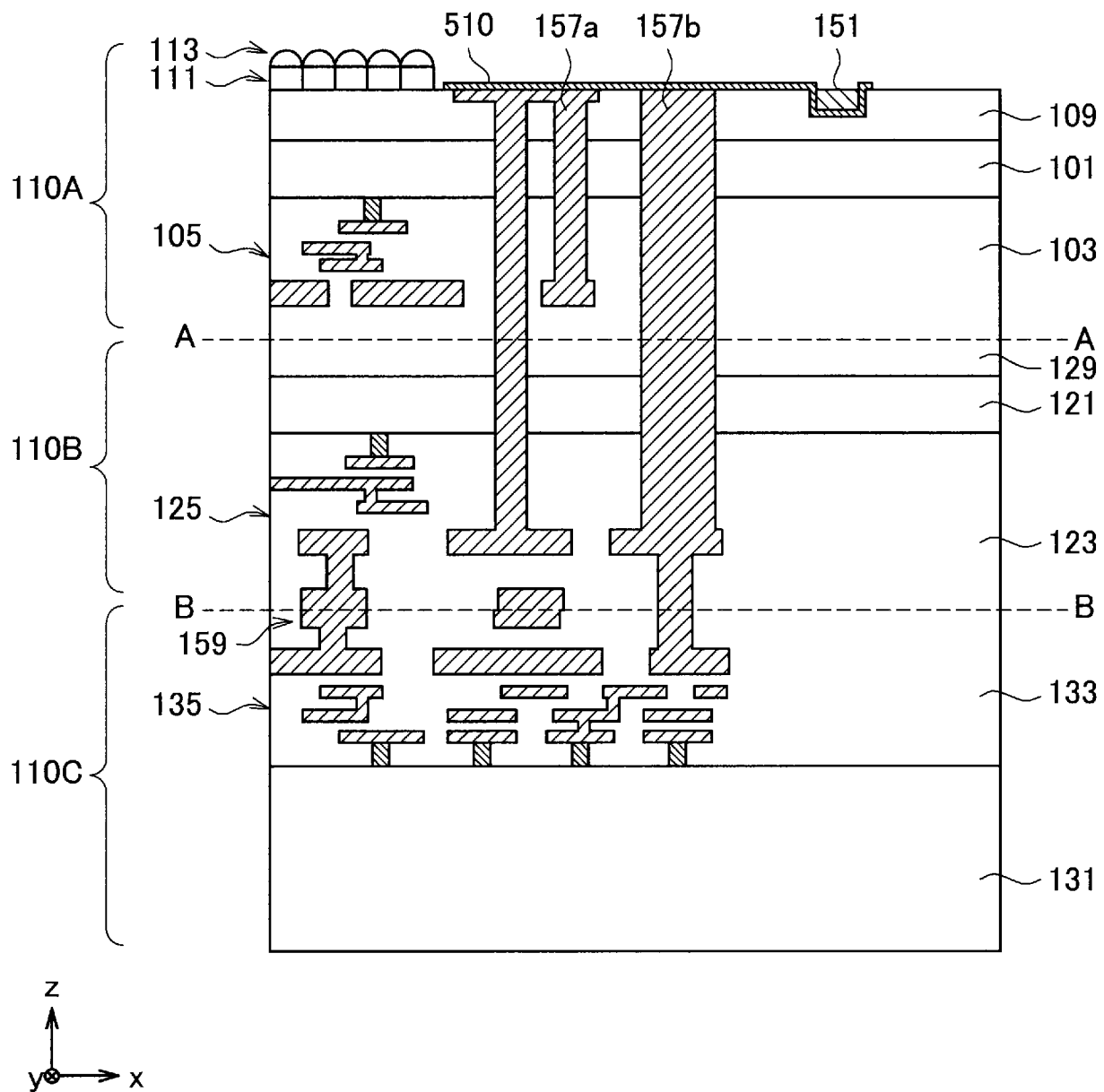
[図15F]



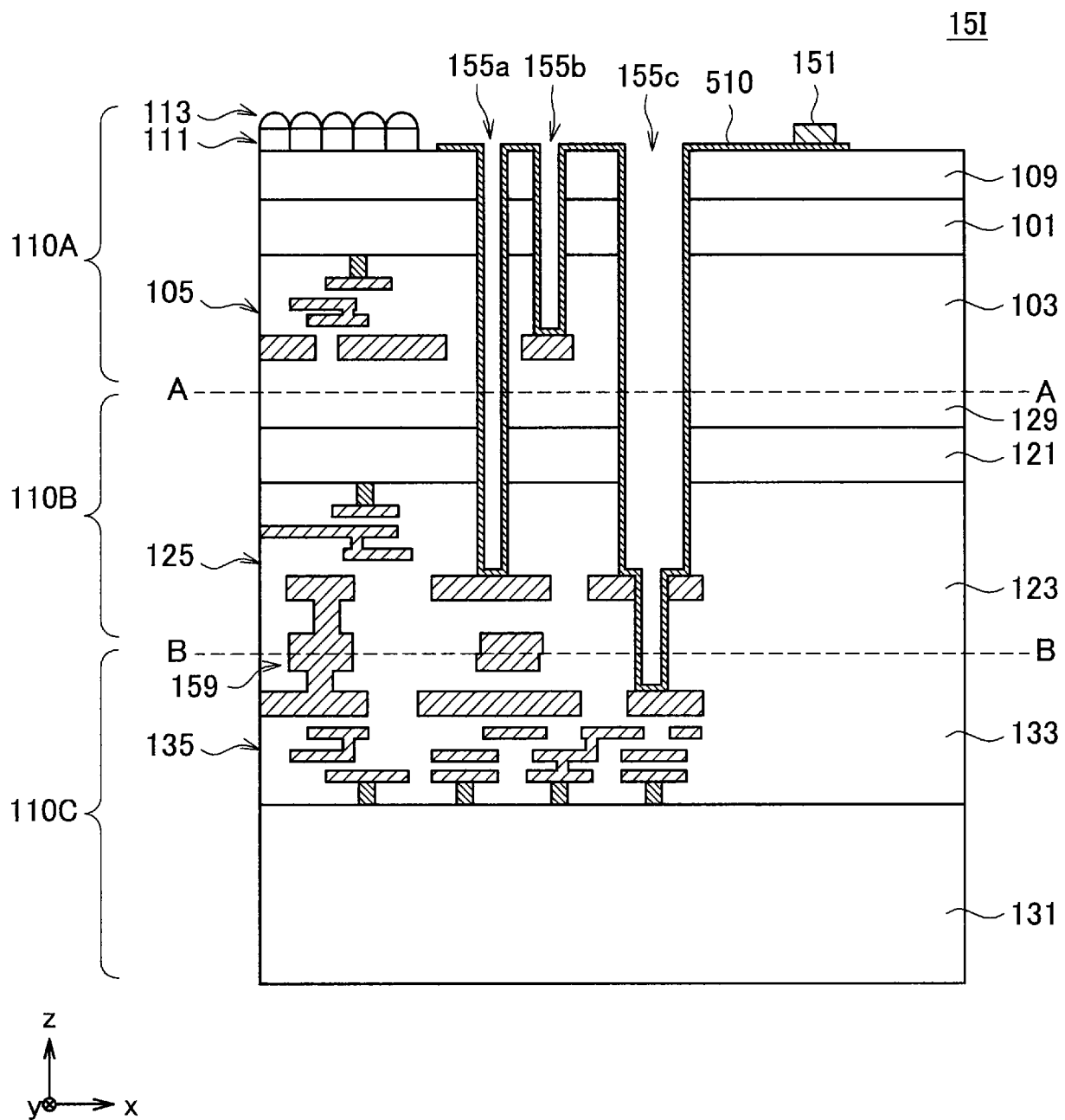
[図15G]



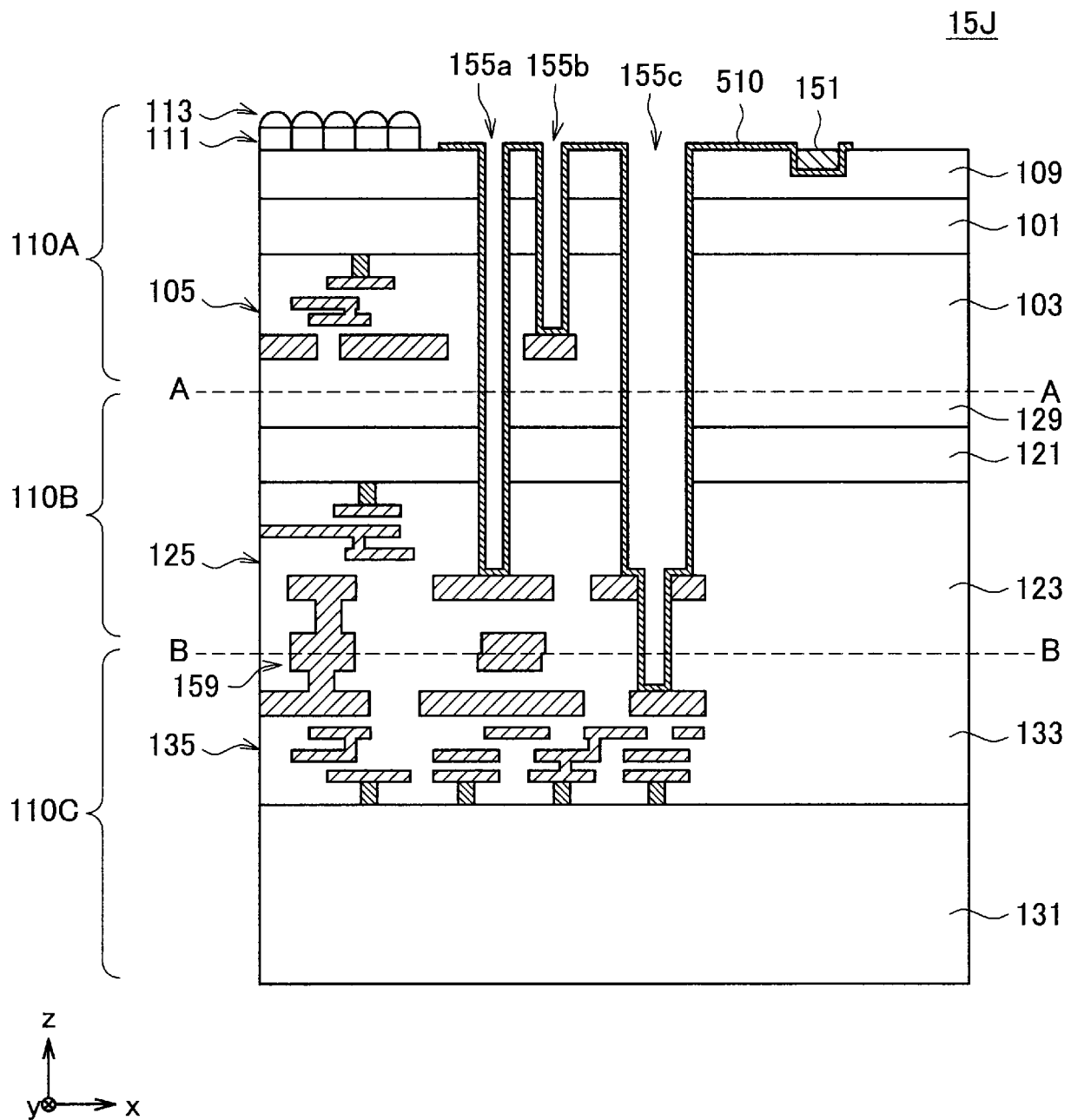
[図15H]

15H

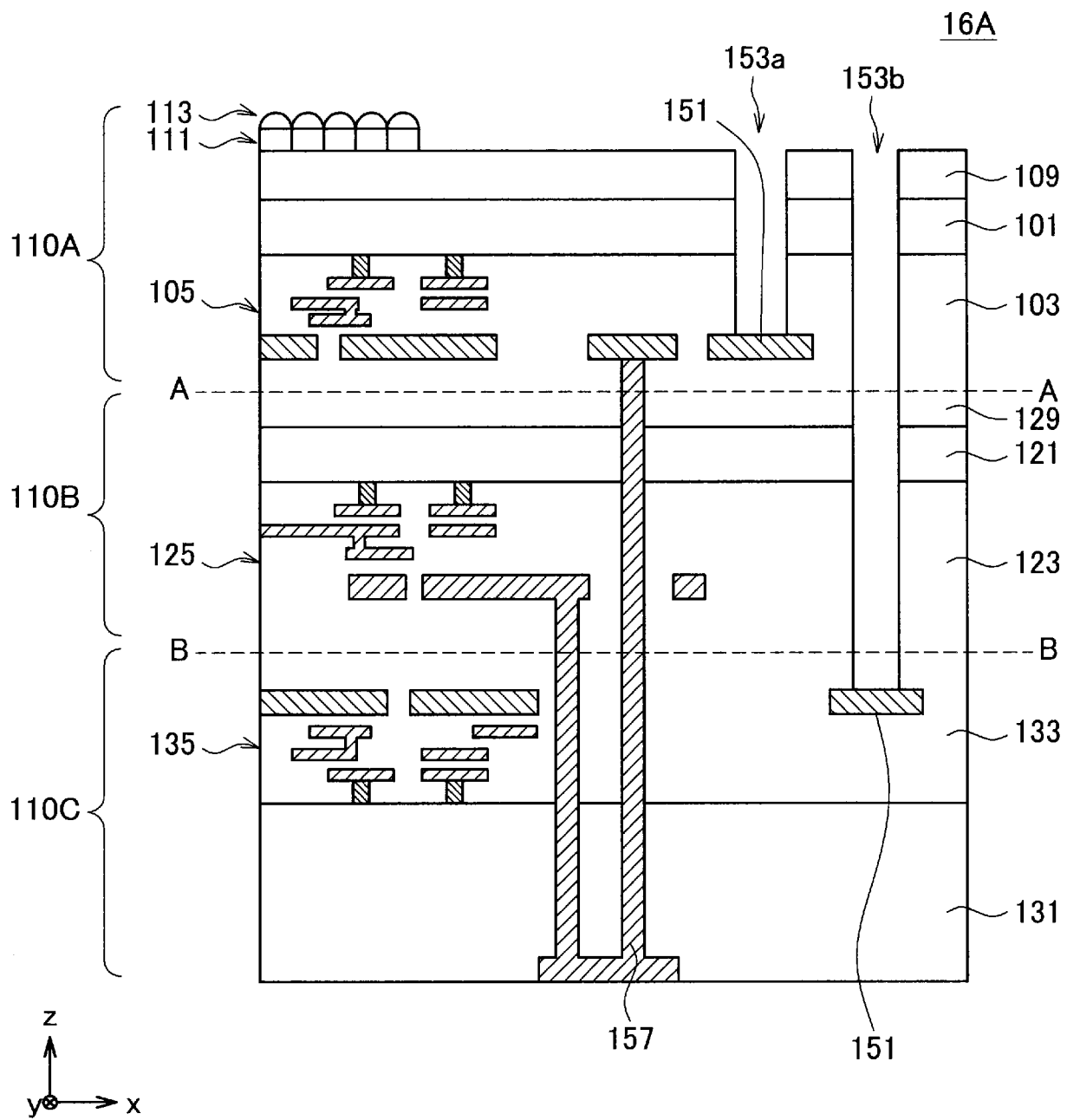
[図15I]



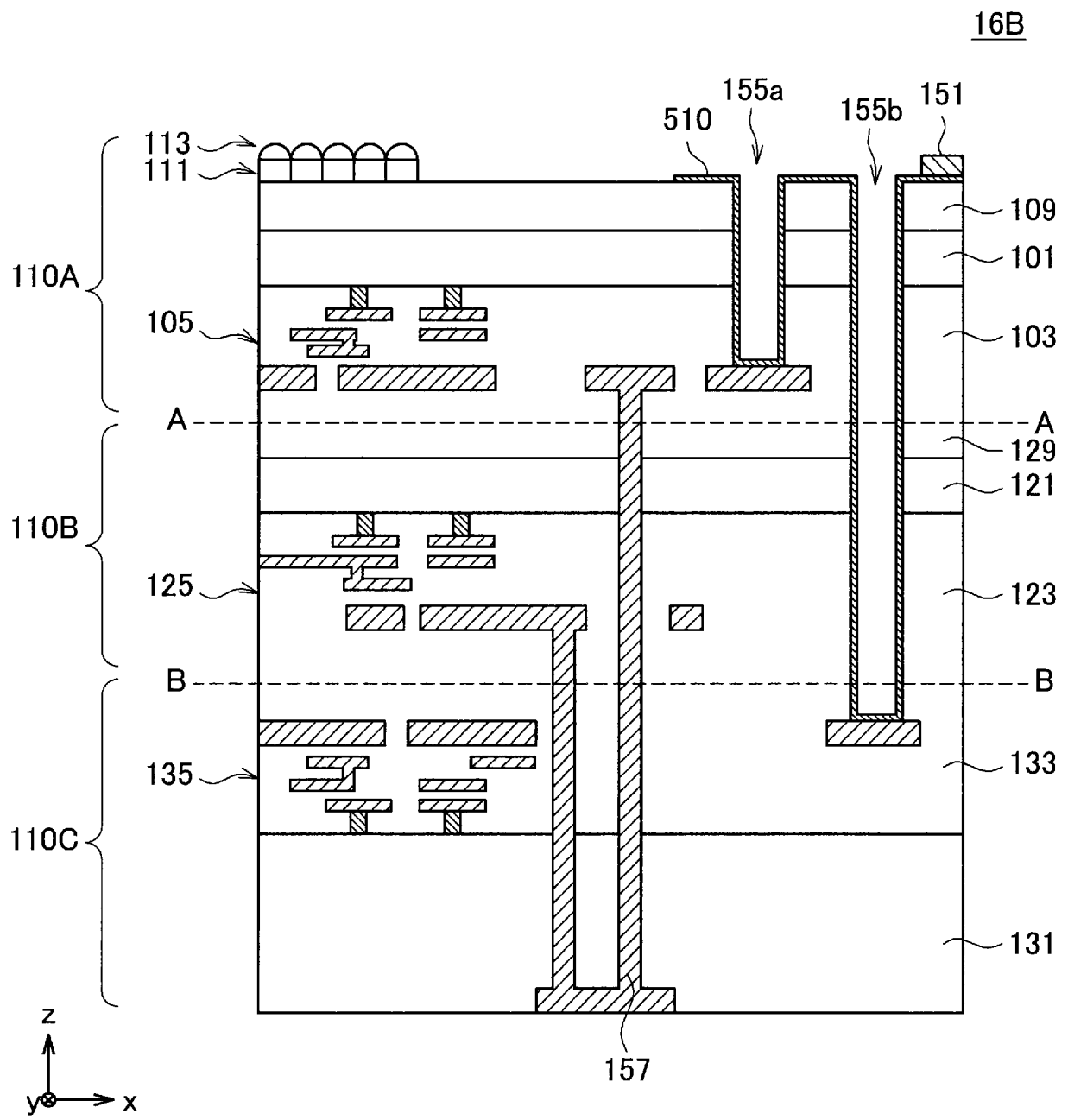
[図15J]



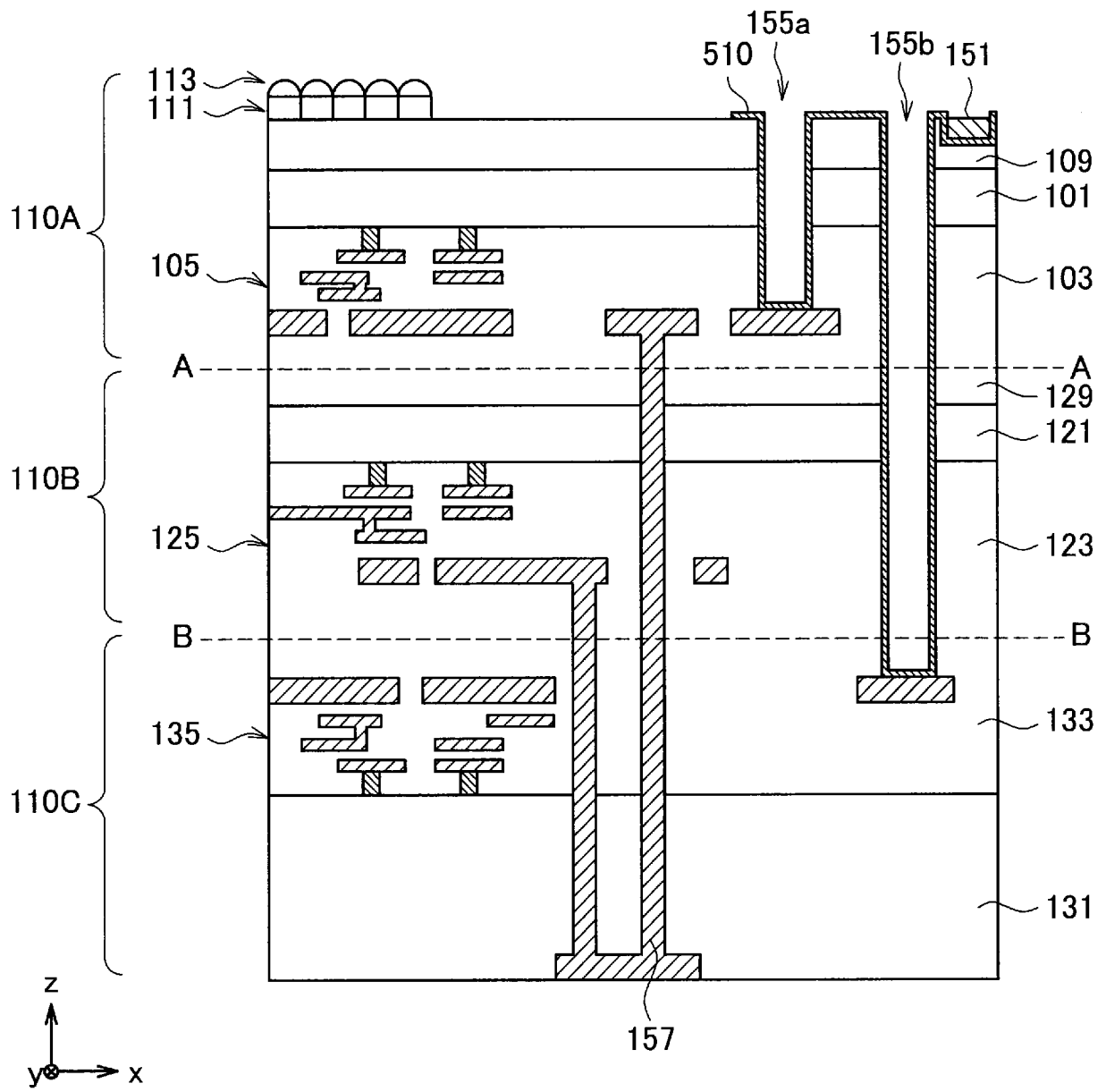
[図16A]



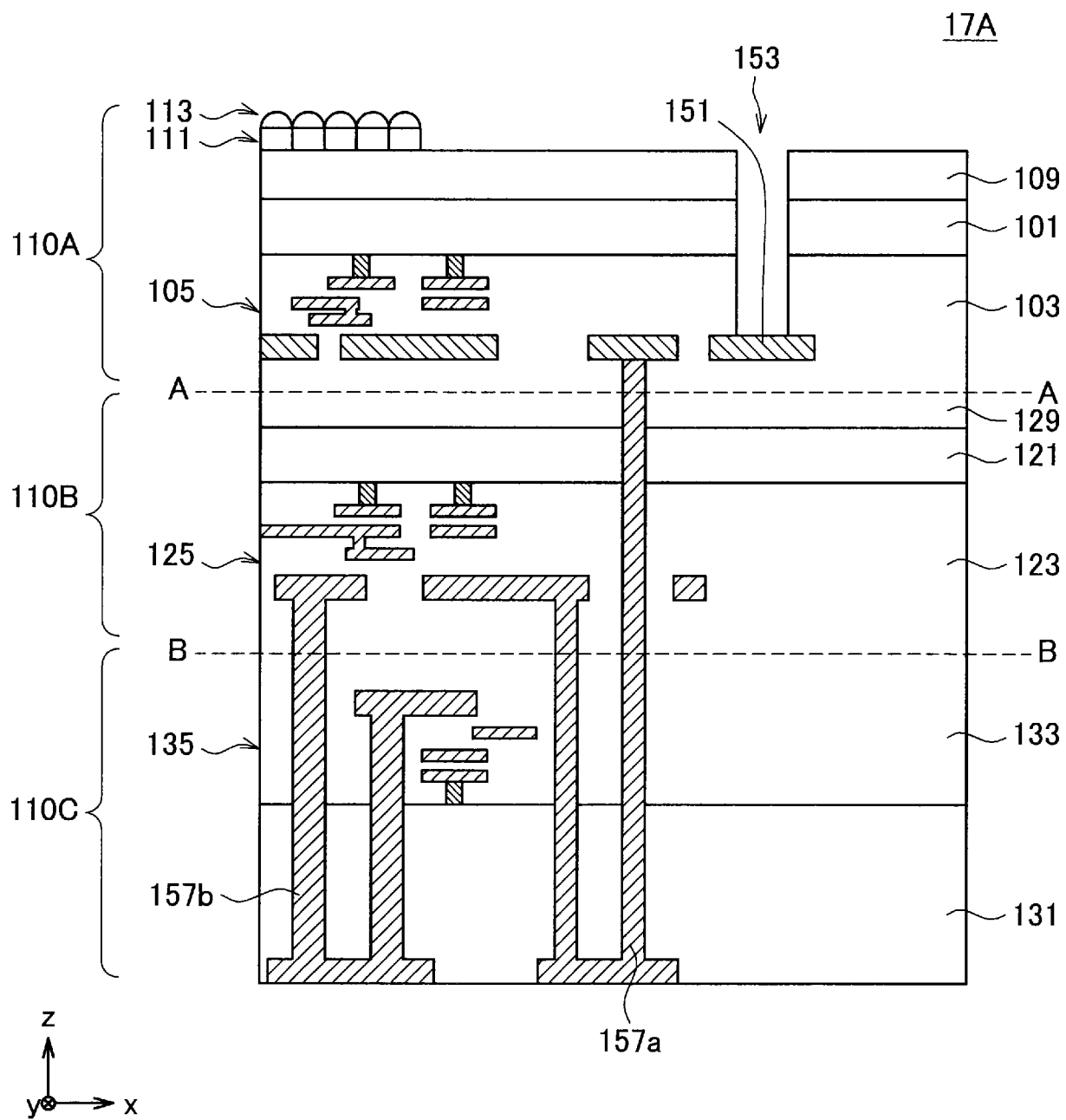
[図16B]



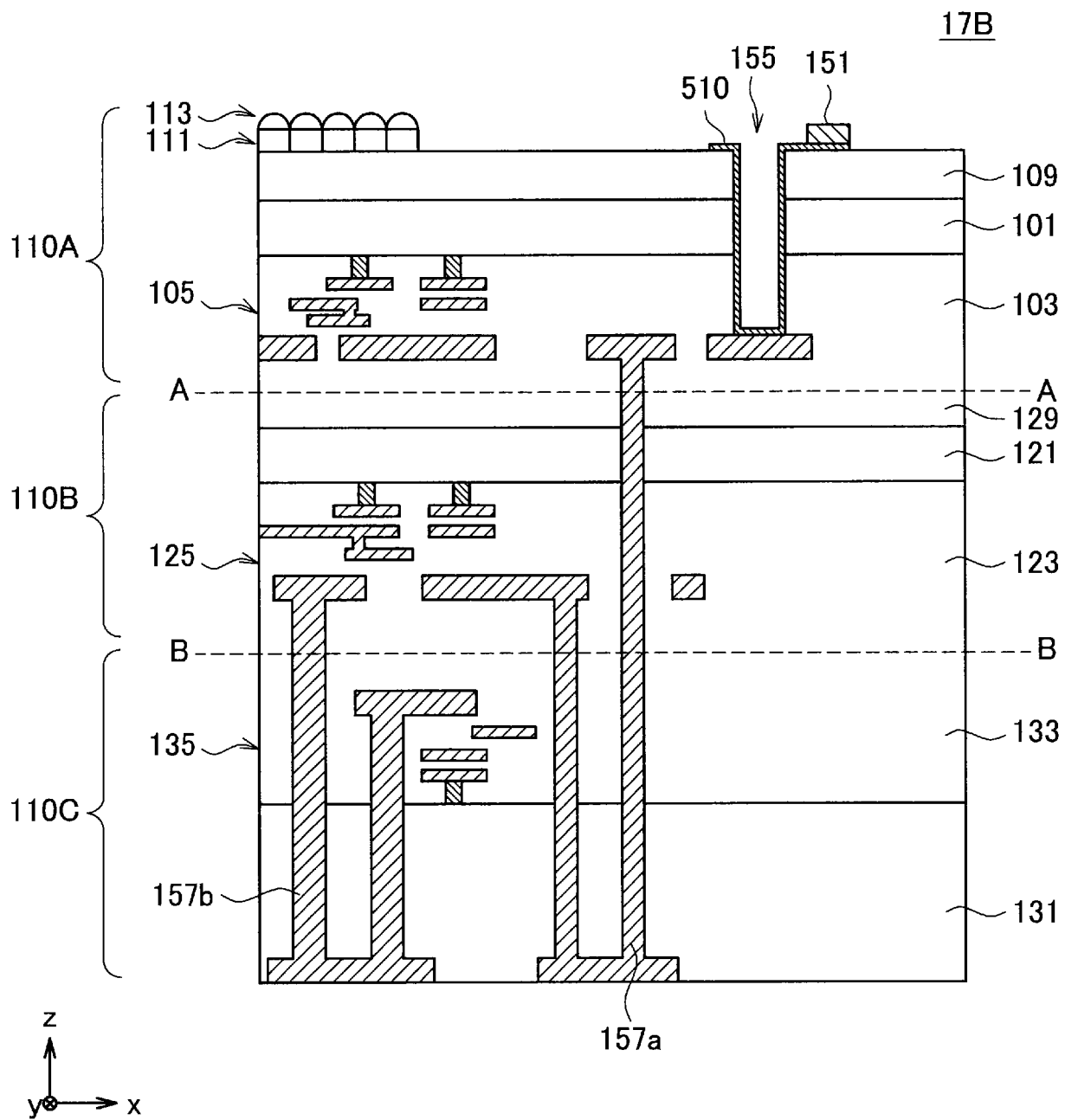
16C



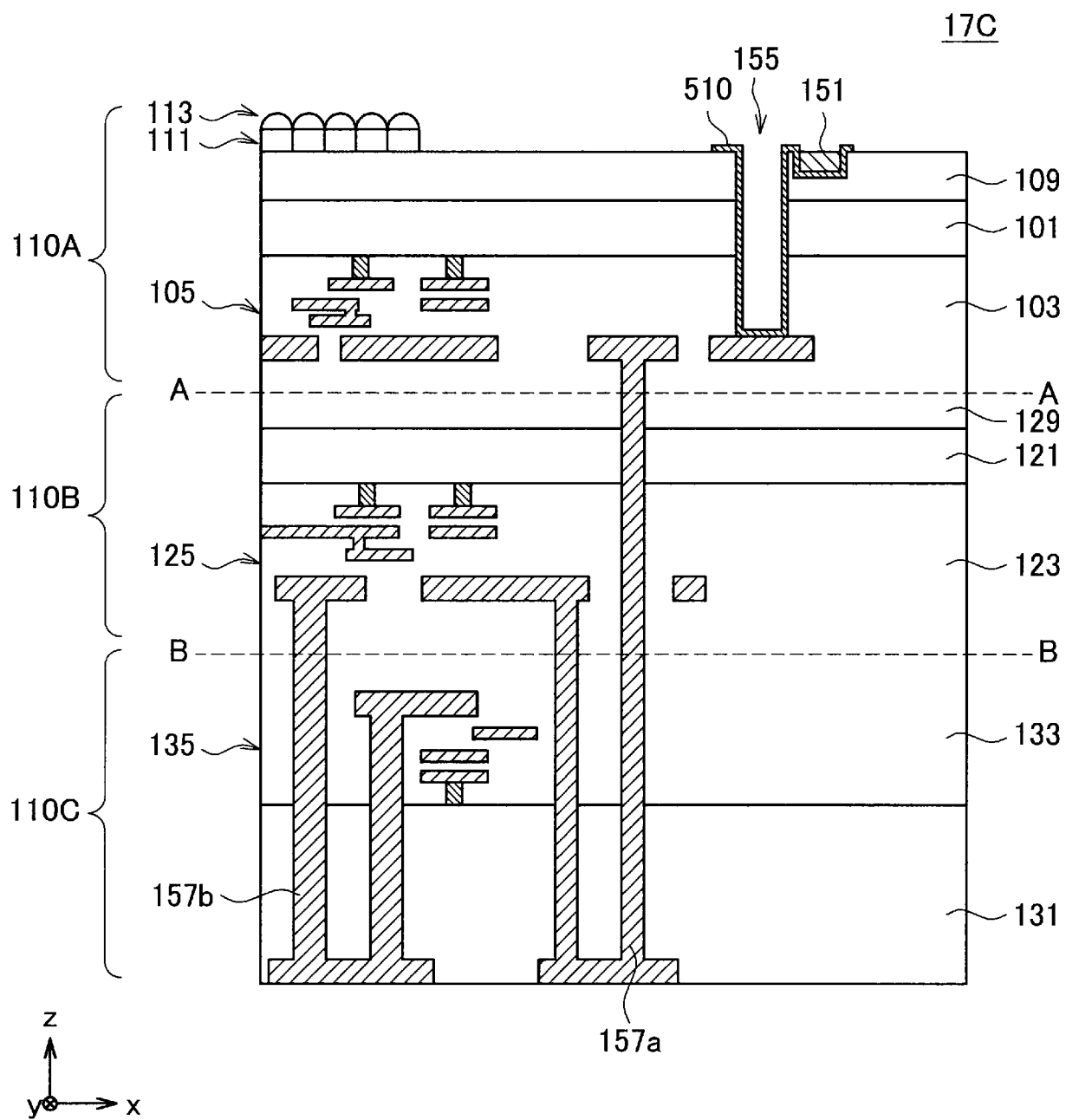
[図17A]



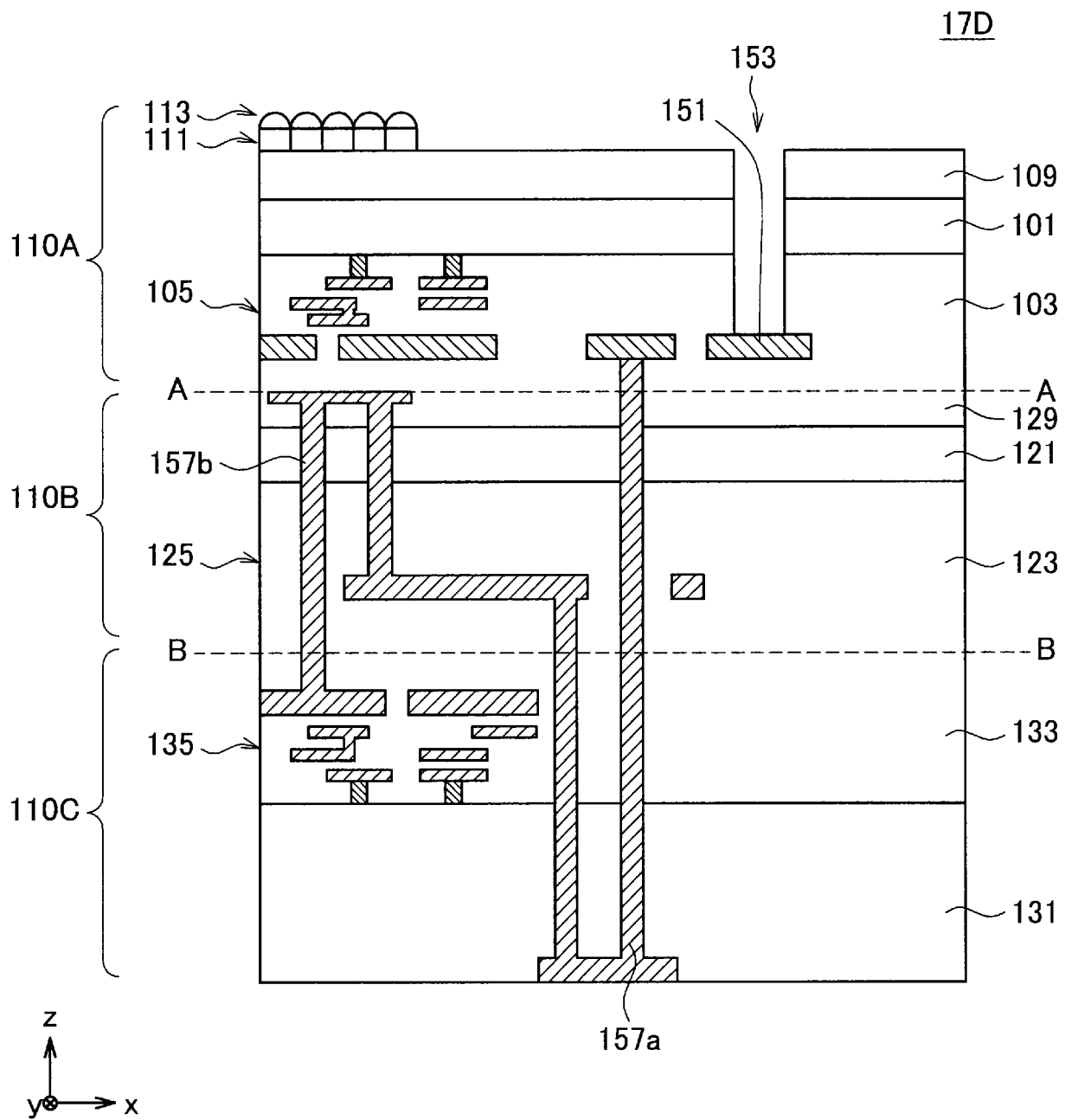
[図17B]



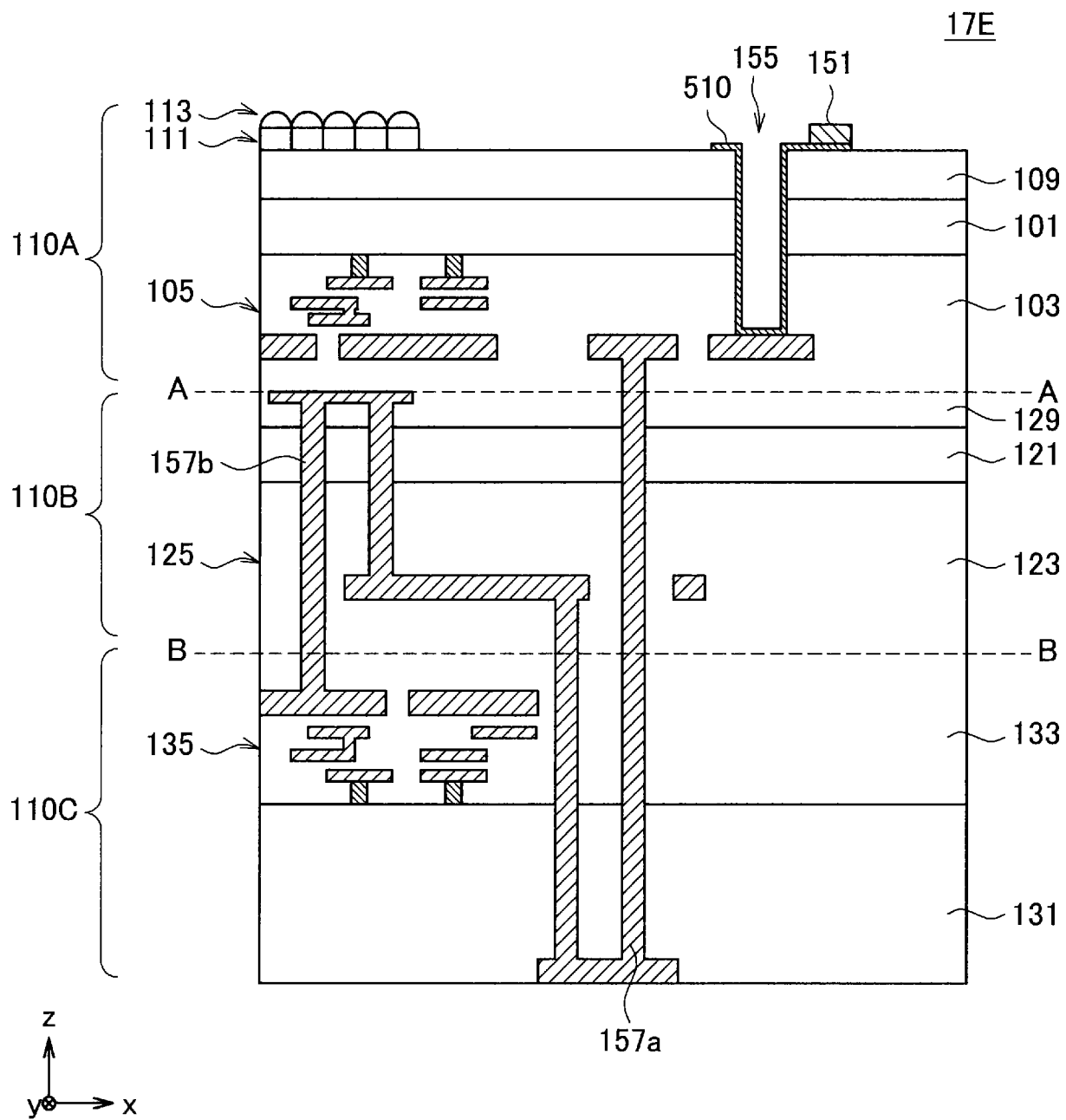
[図17C]



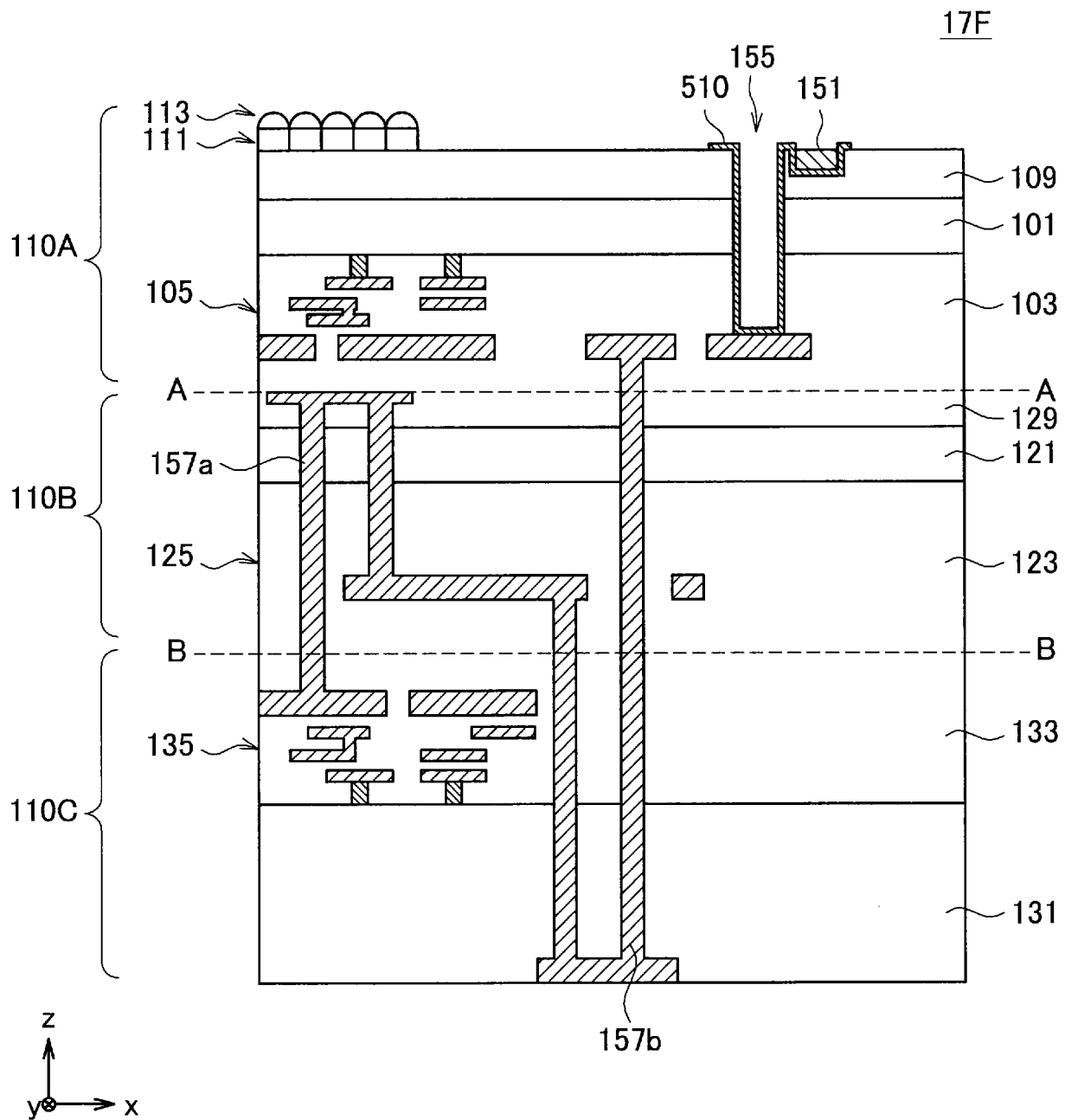
[図17D]



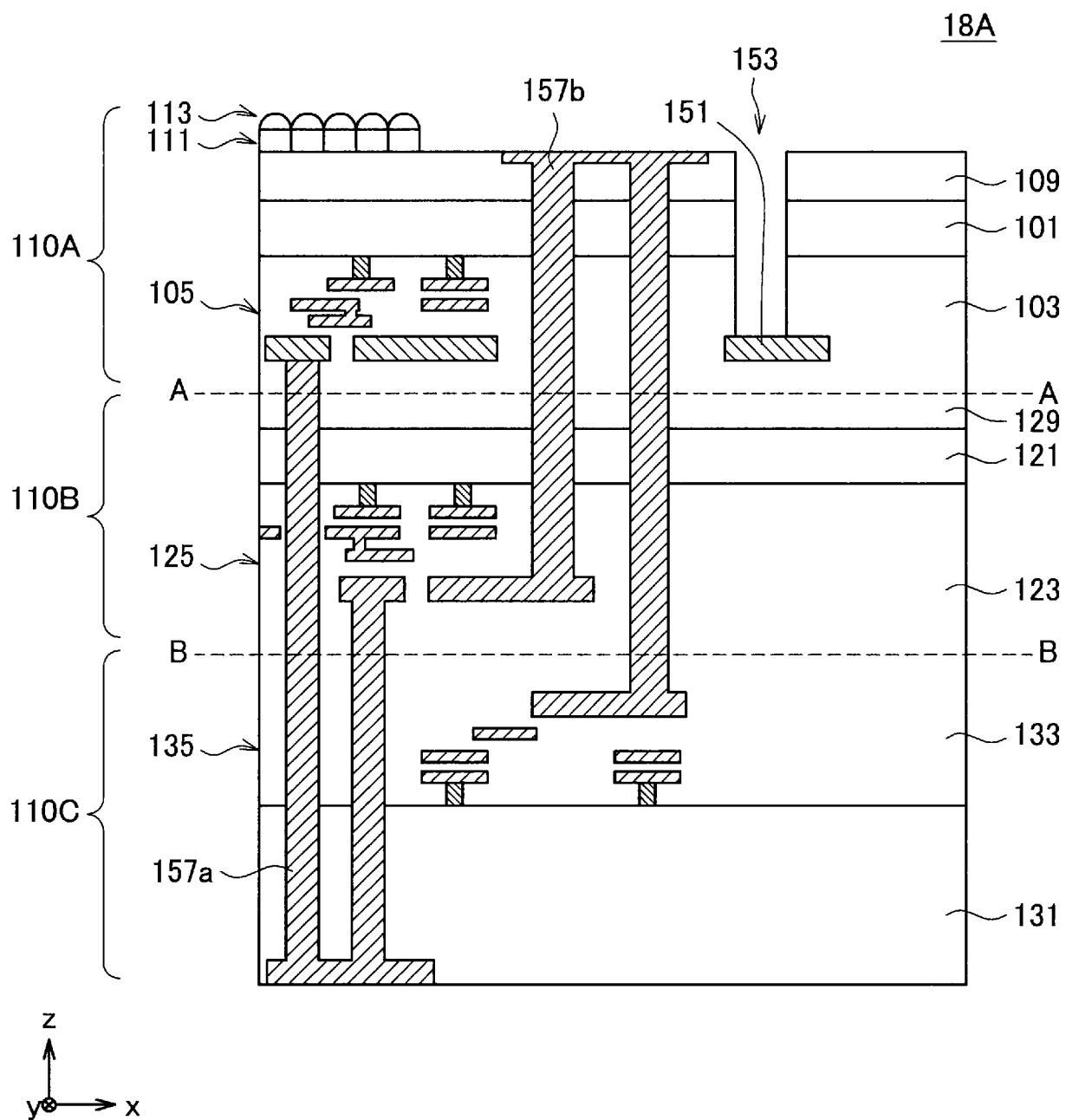
[図17E]



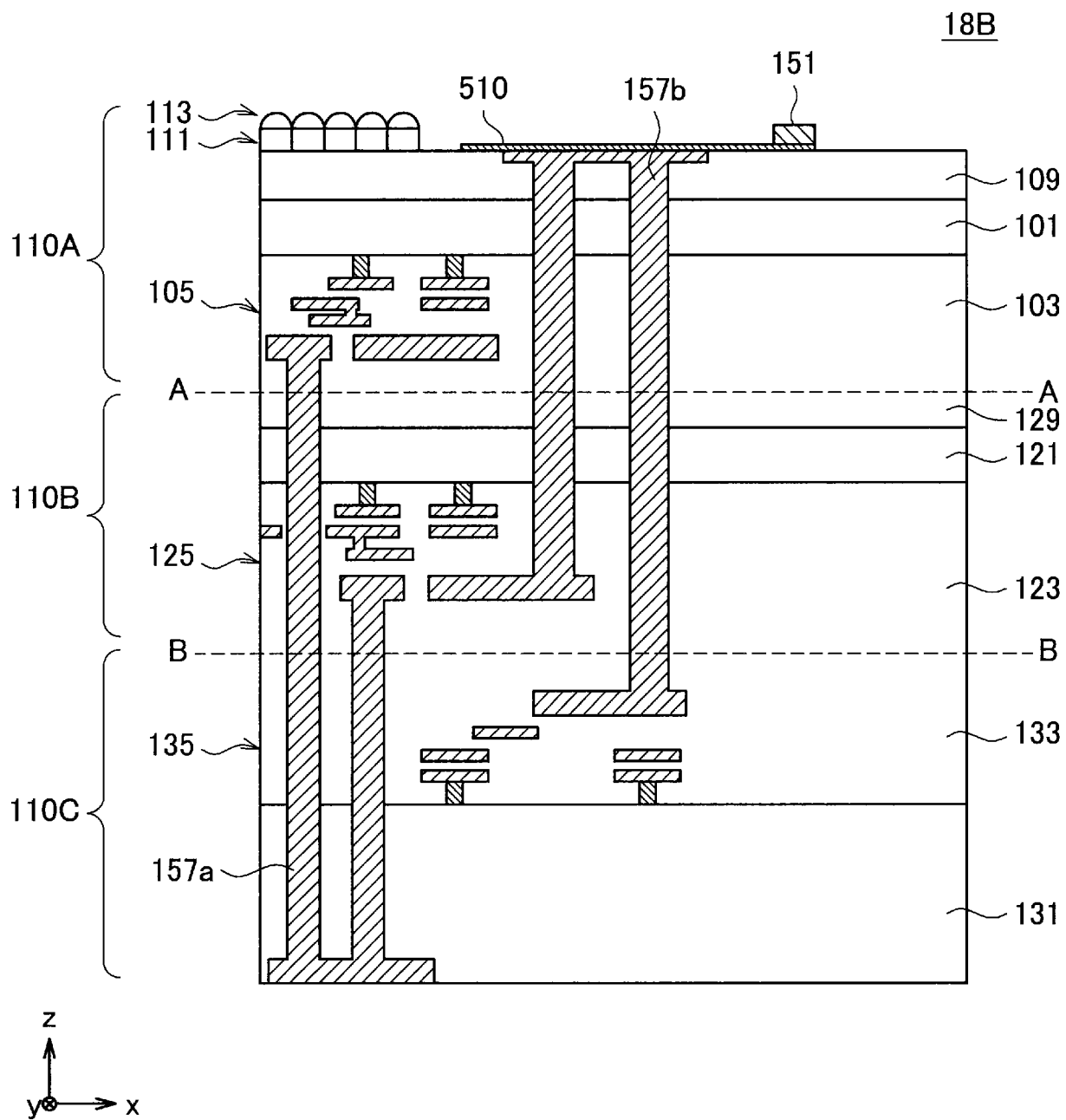
[図17F]



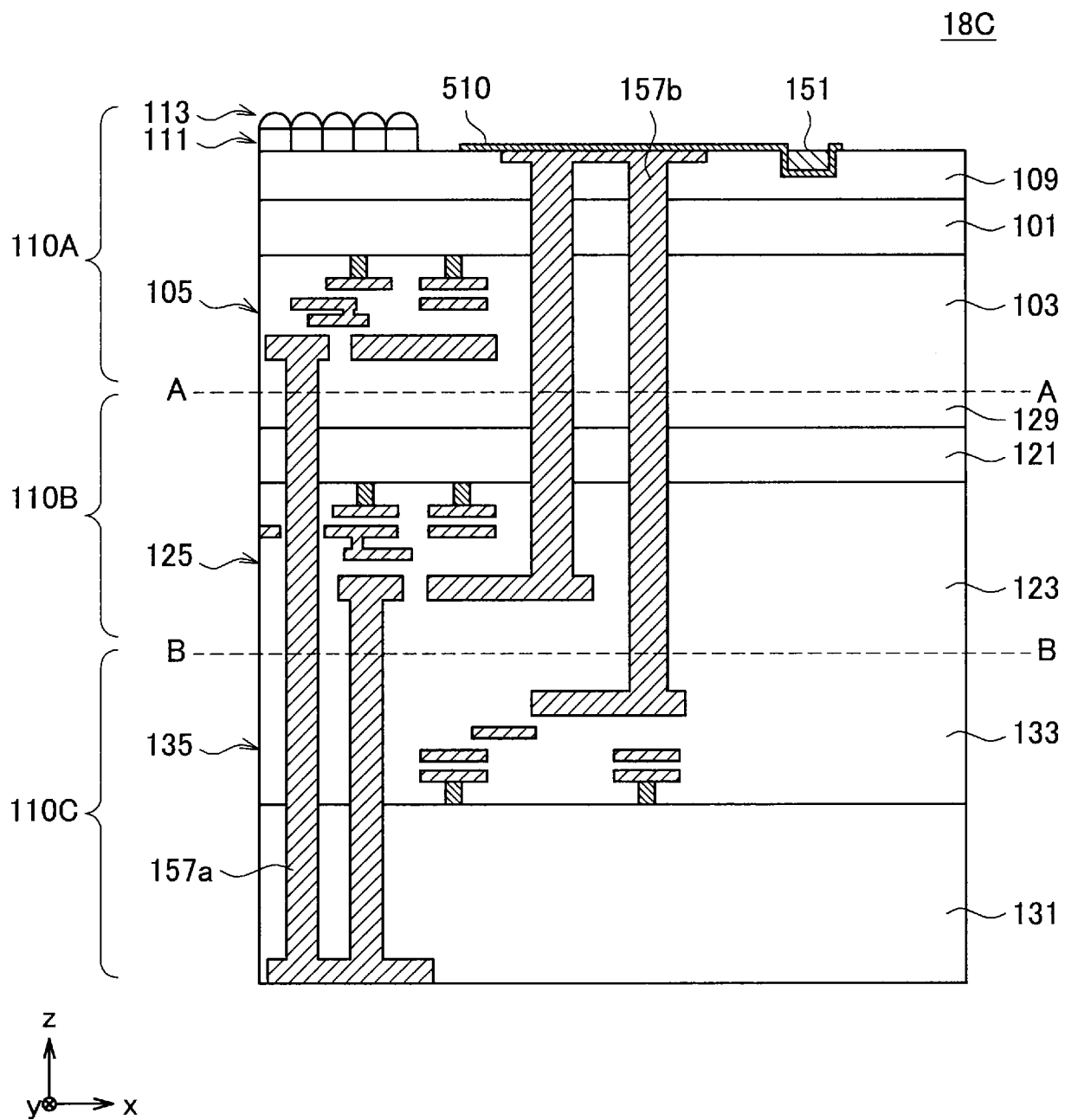
[図18A]



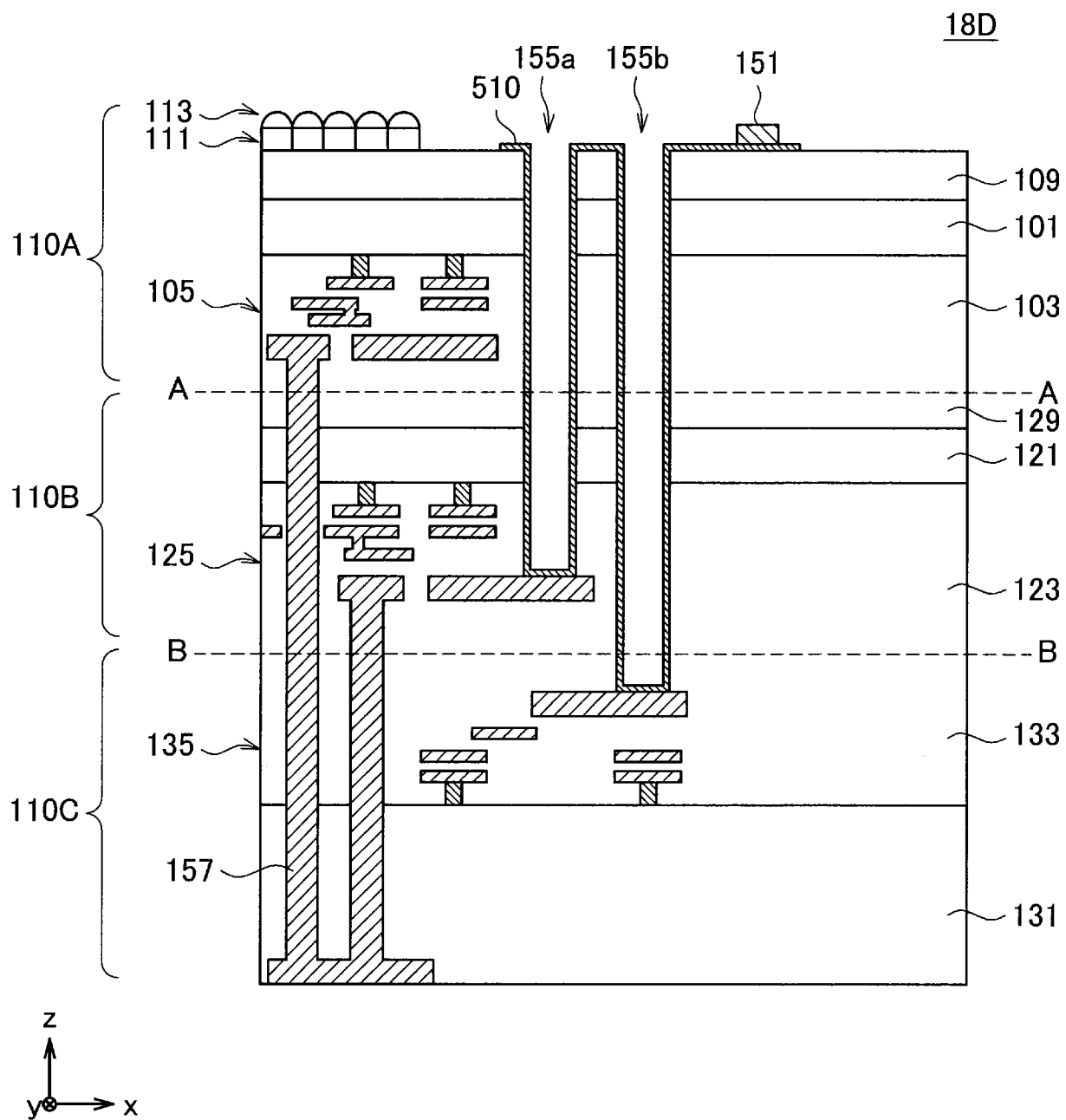
[図18B]



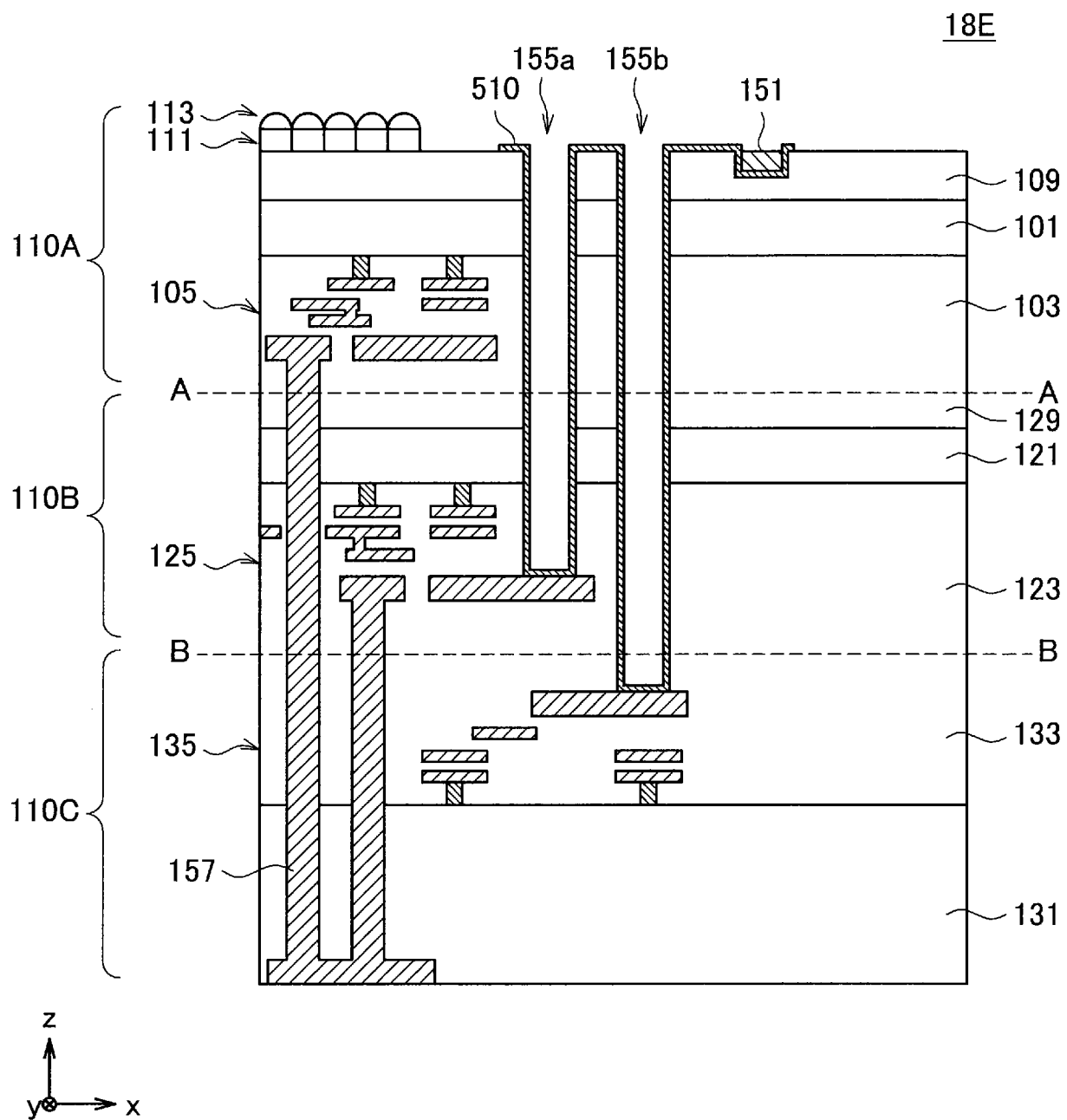
[図18C]



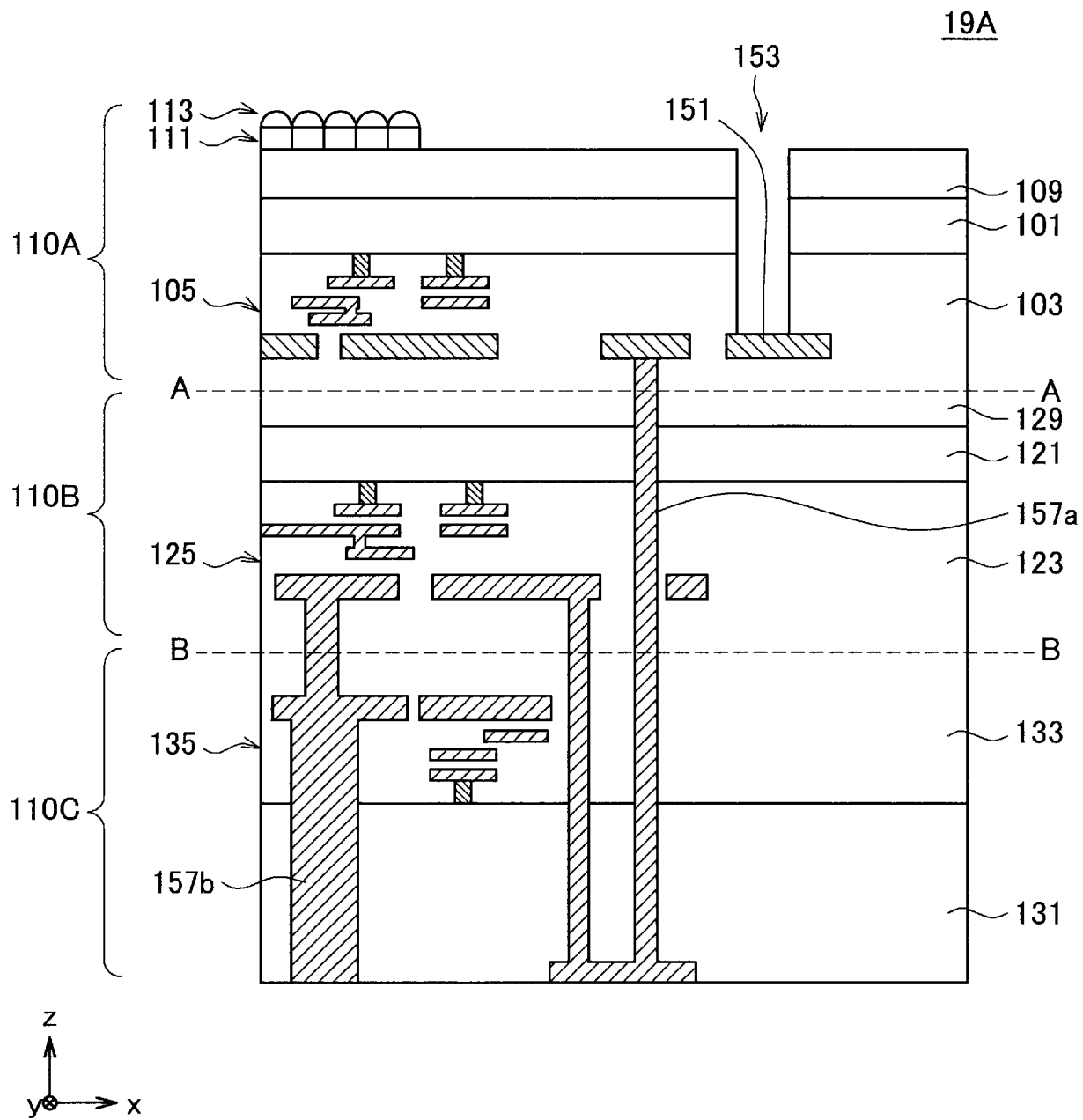
[図18D]



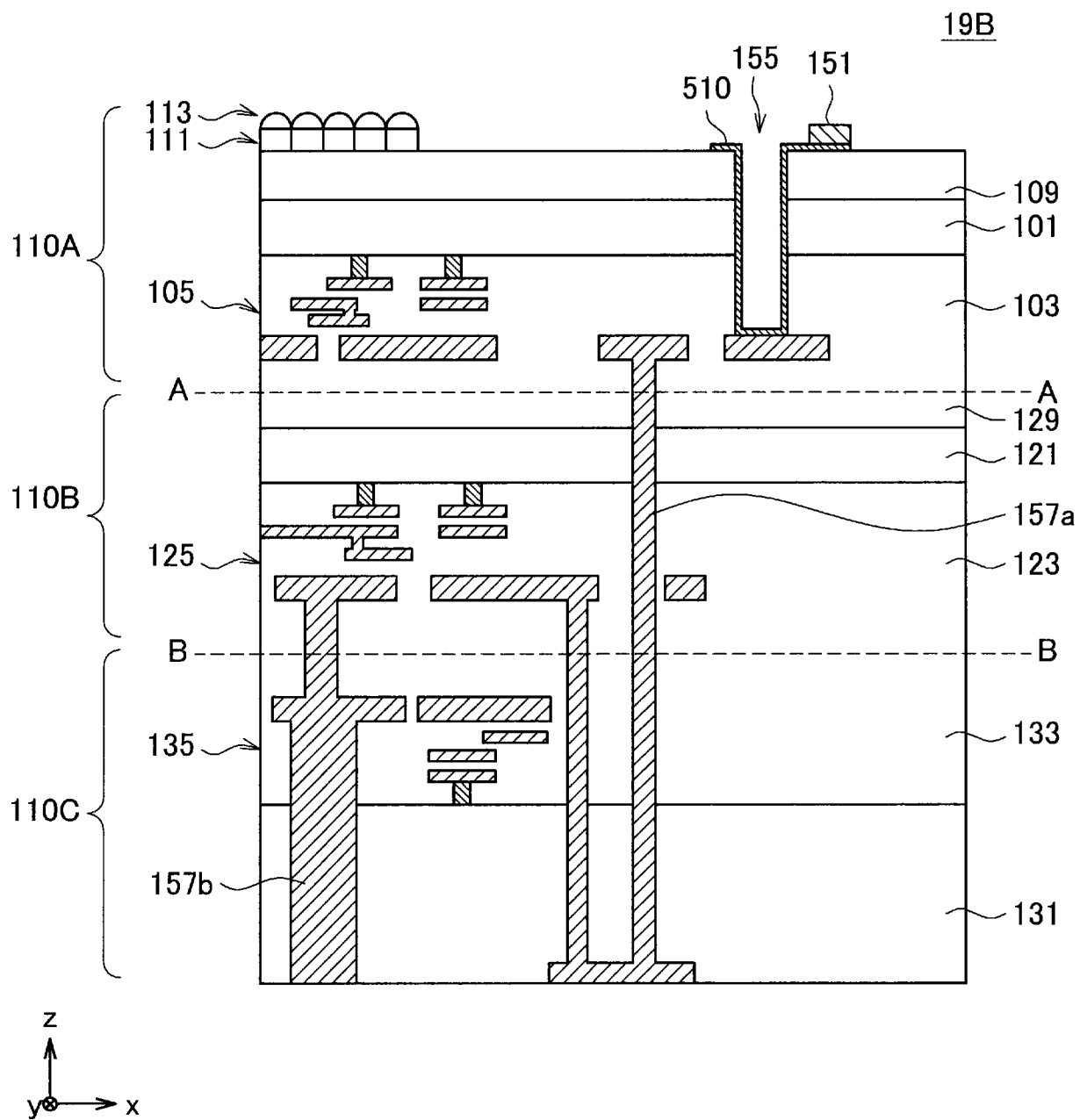
[図18E]



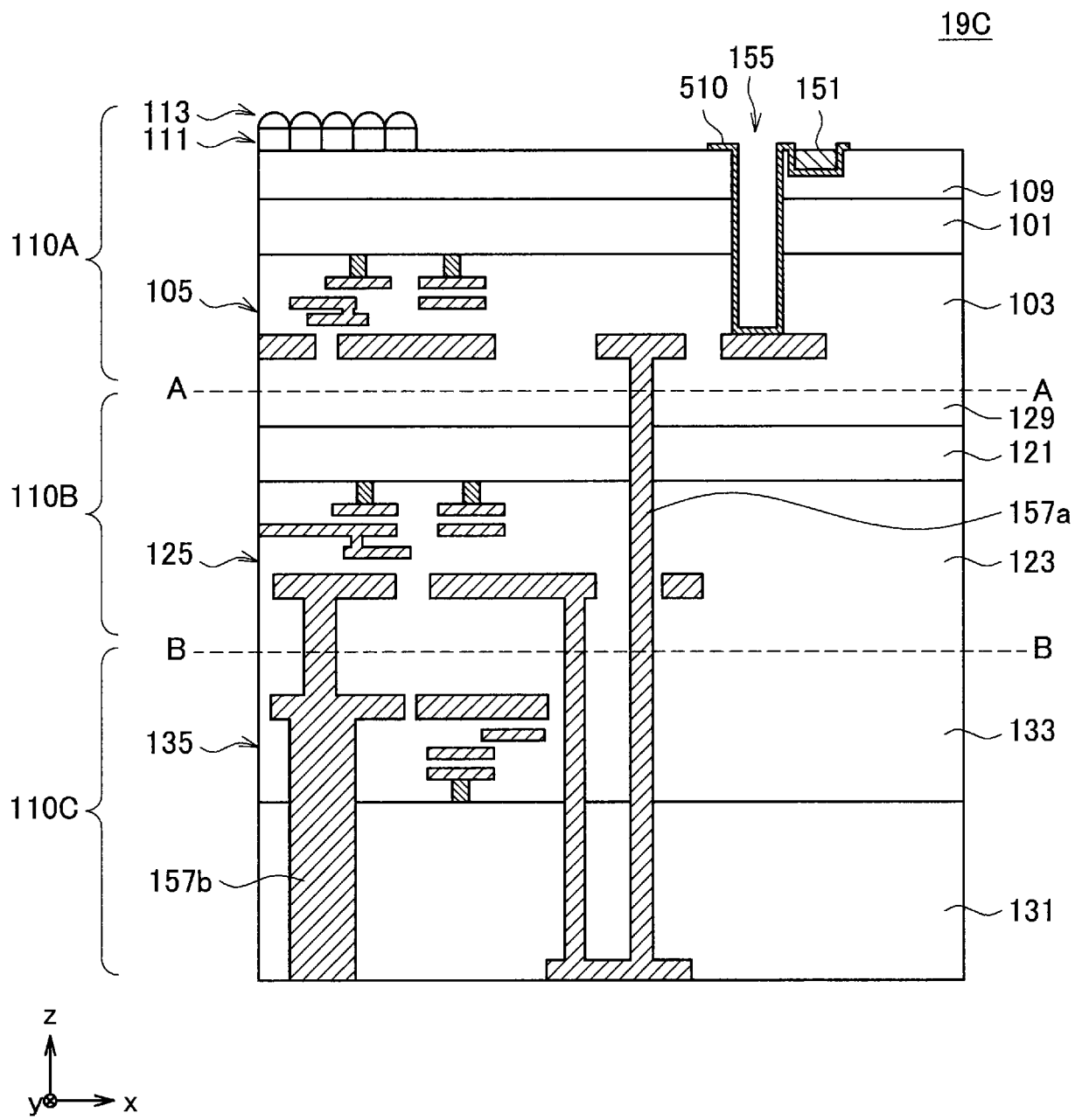
[図19A]



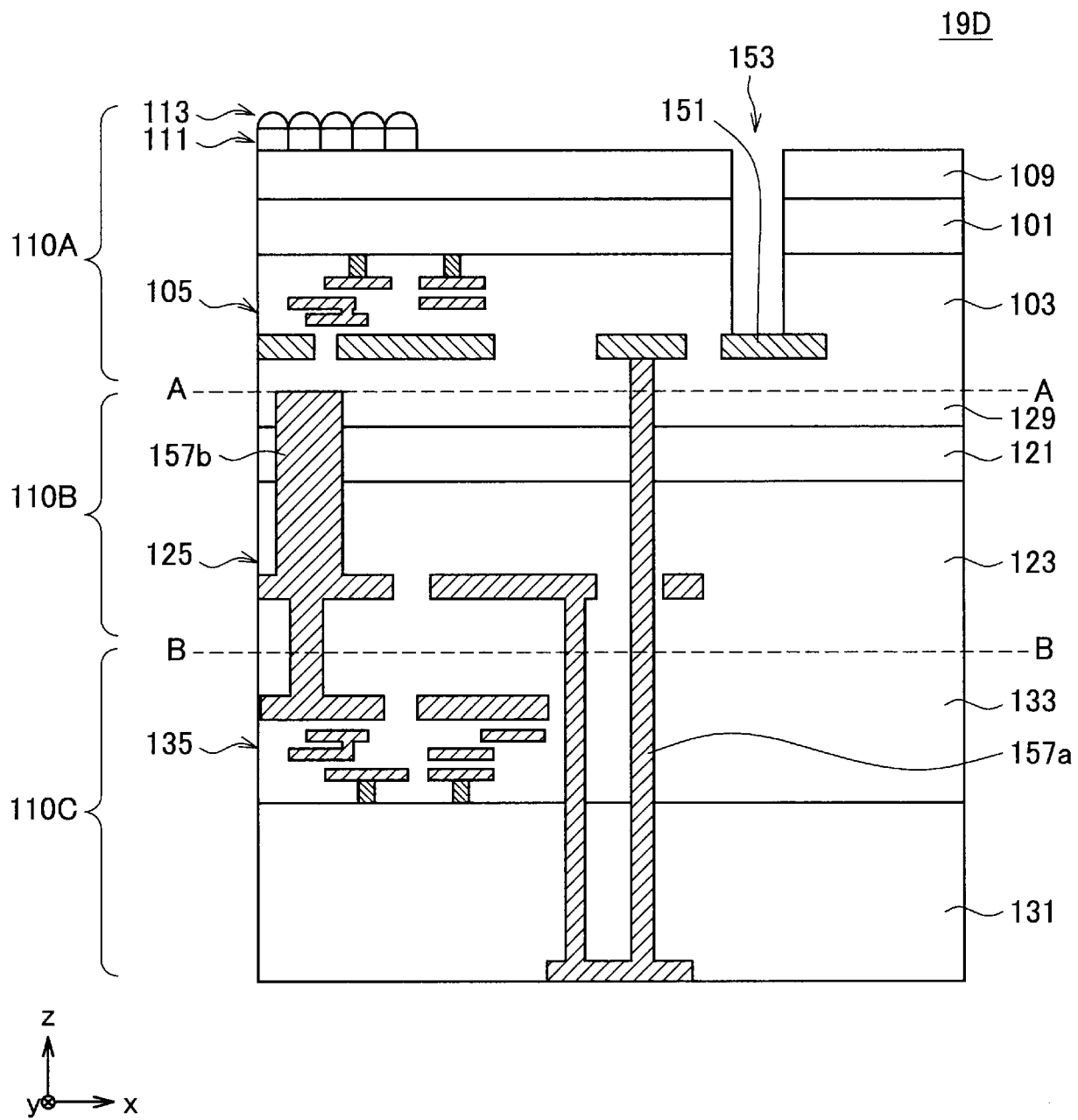
[図19B]



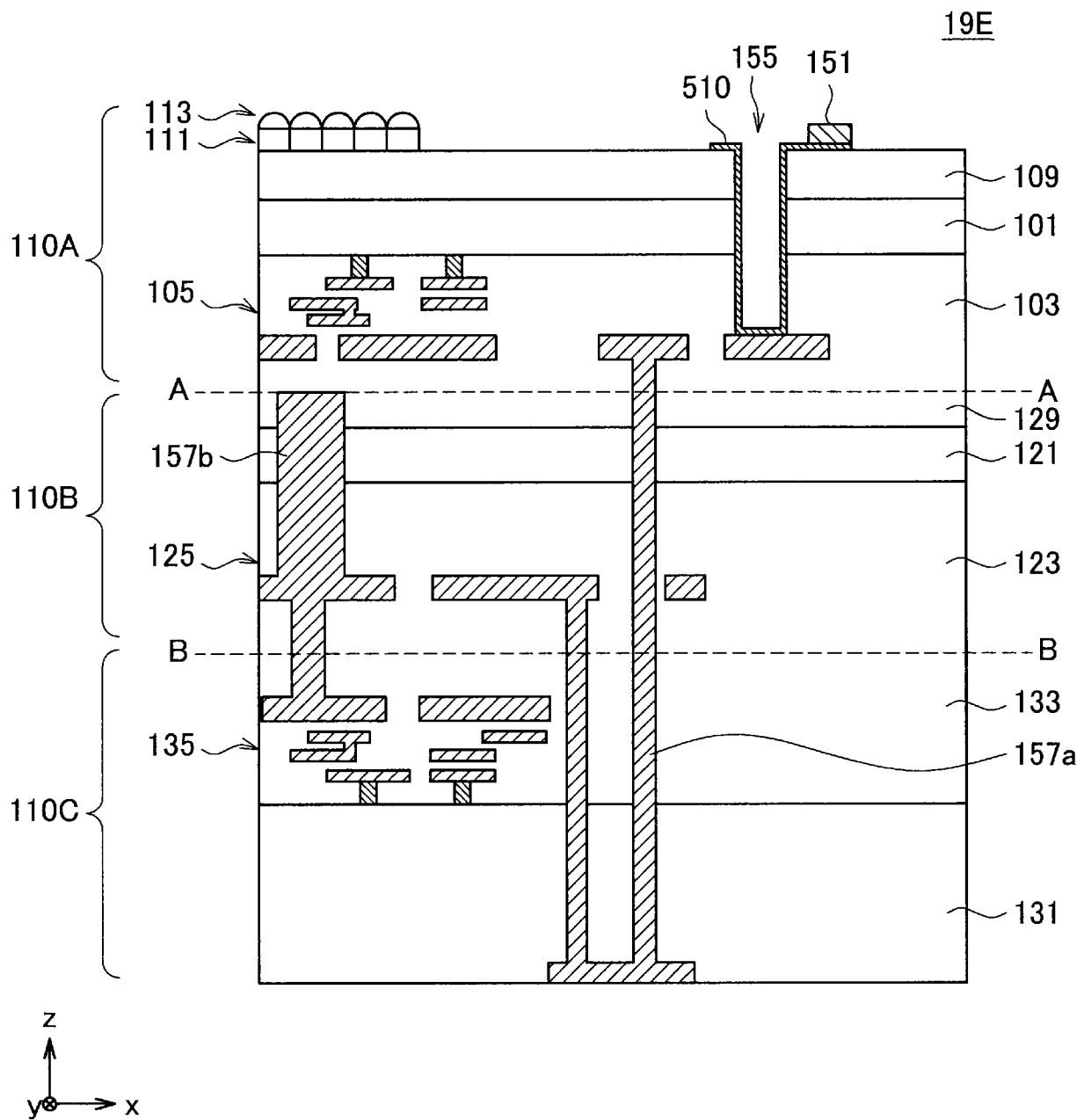
[図19C]



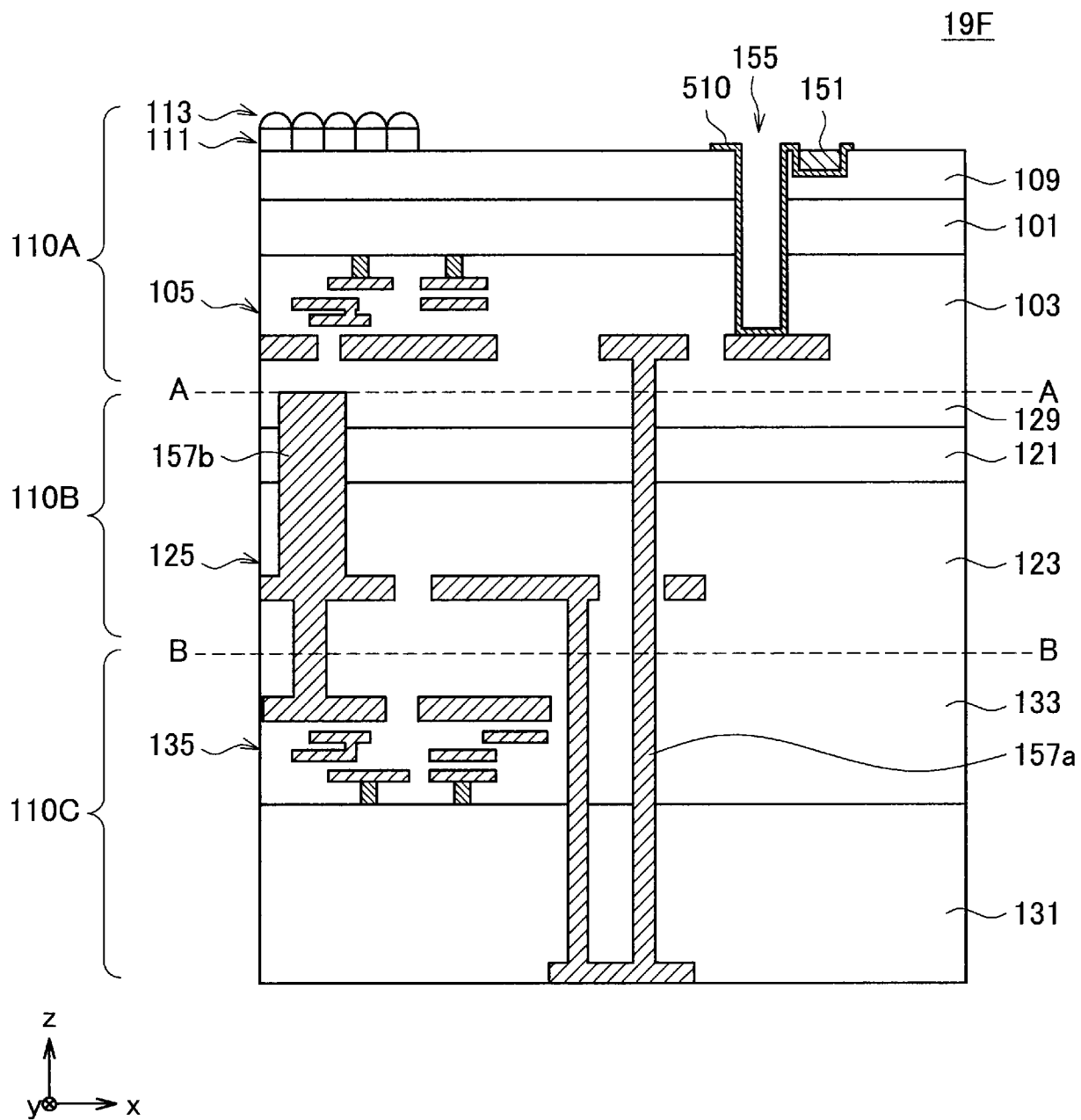
[図19D]



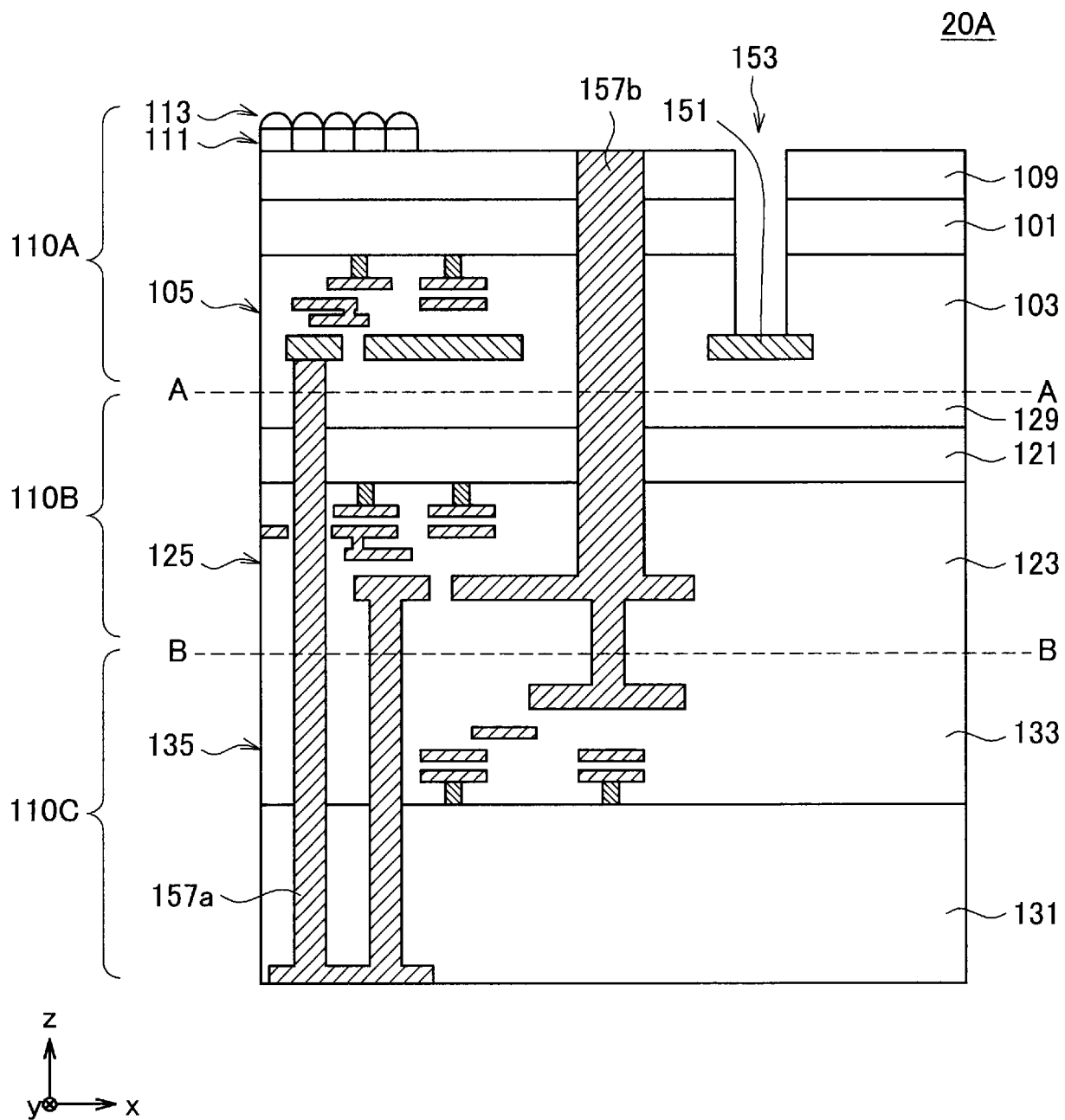
[図19E]



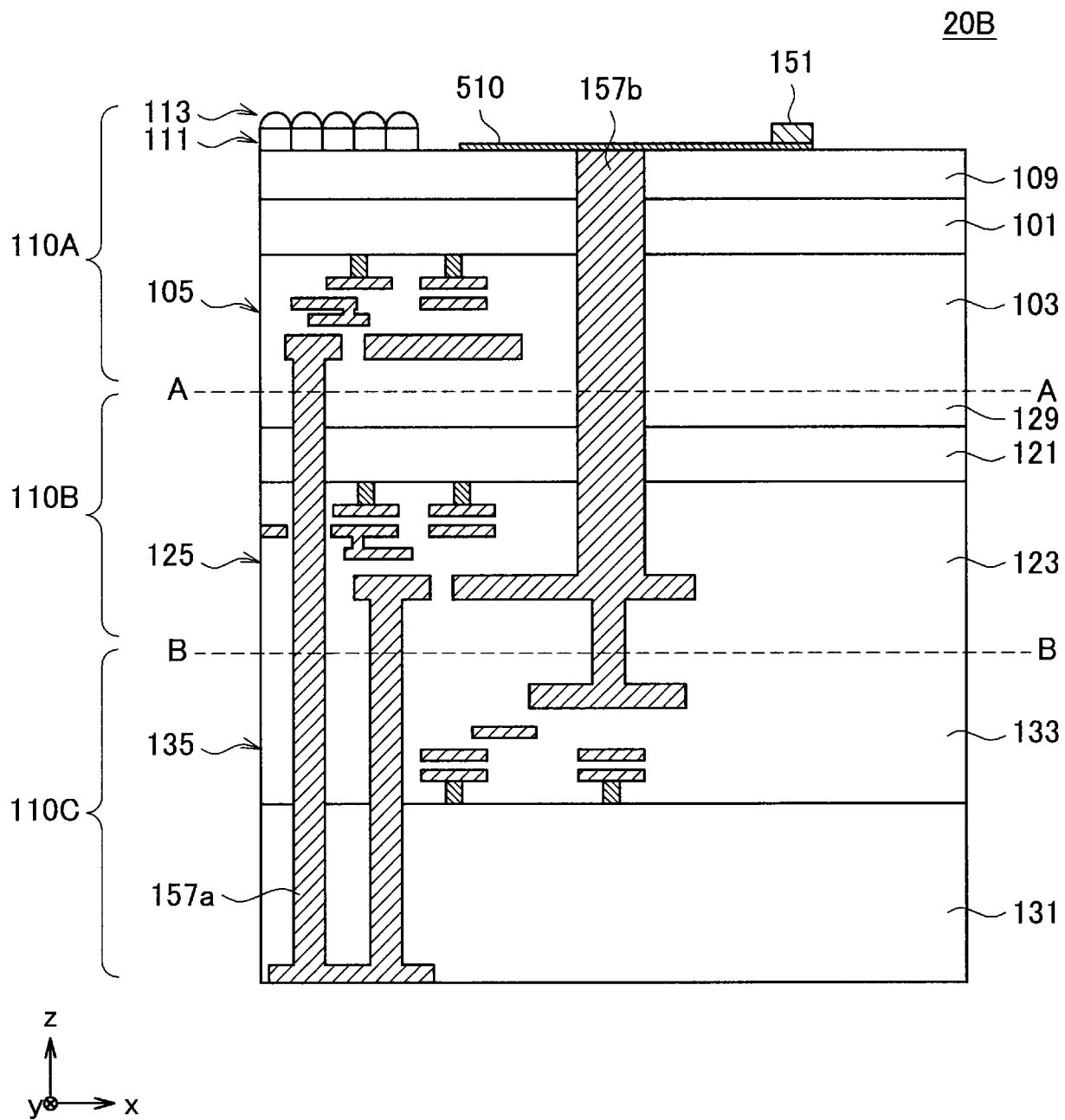
[図19F]



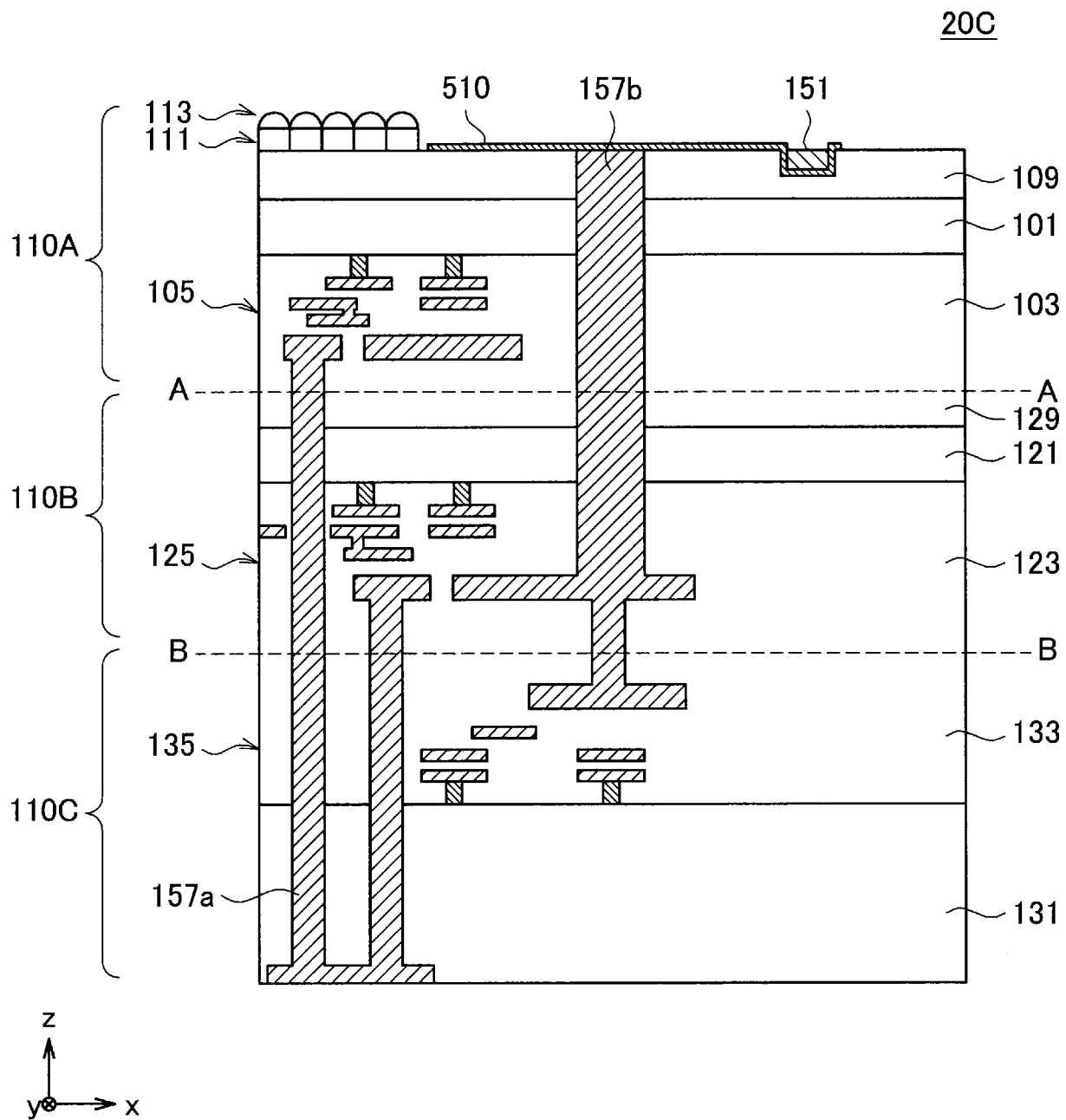
[図20A]



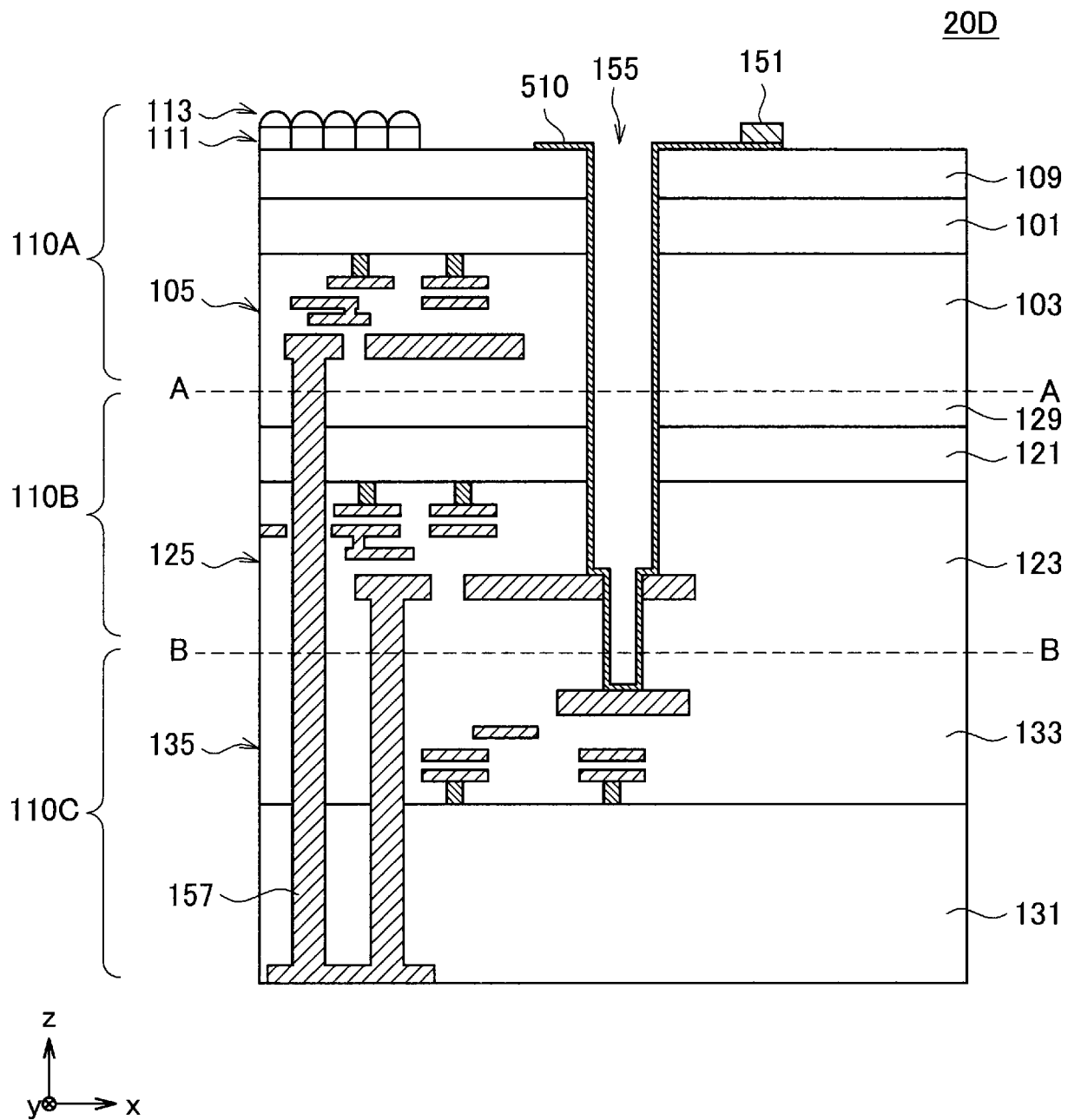
[図20B]



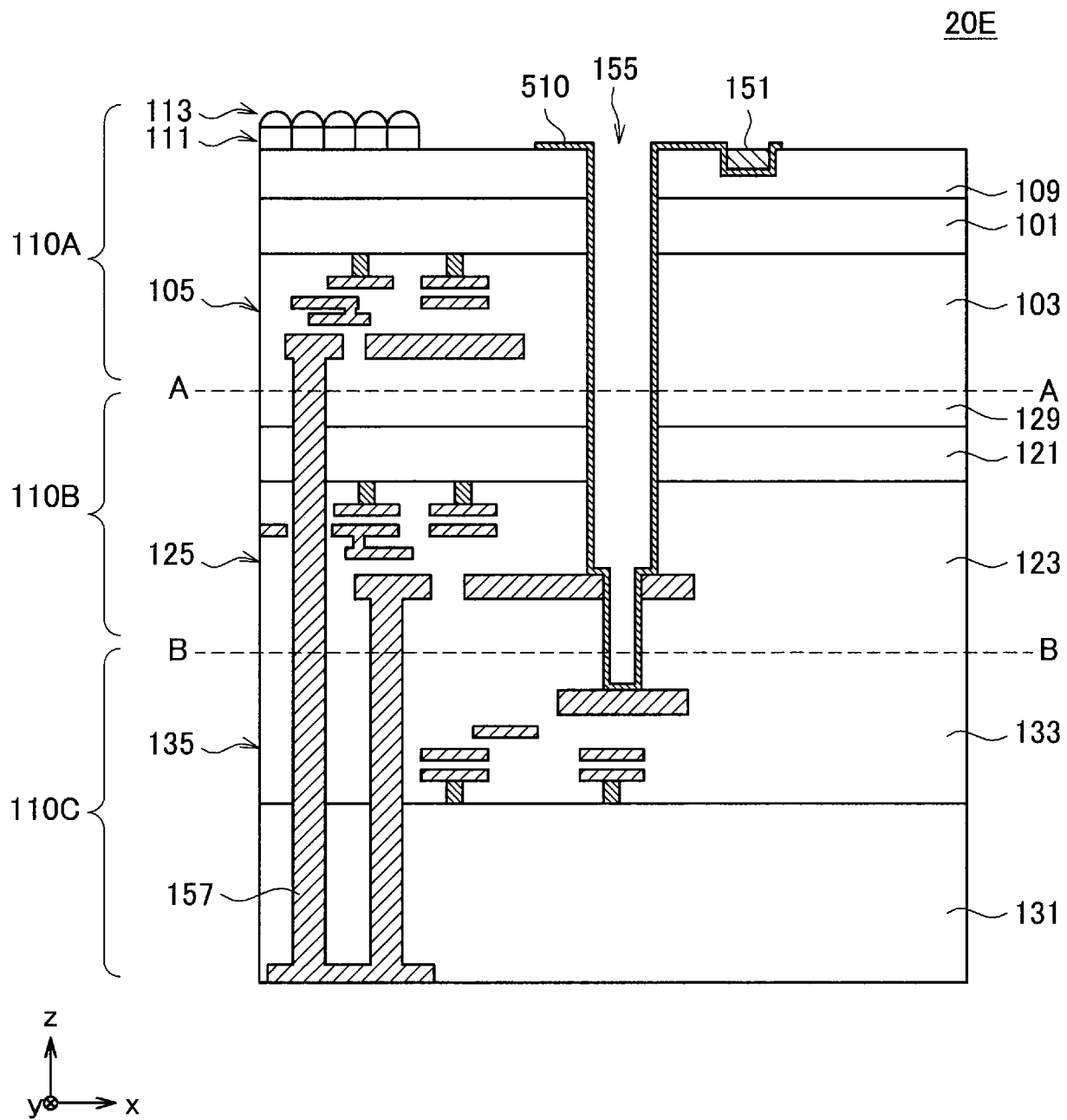
[図20C]



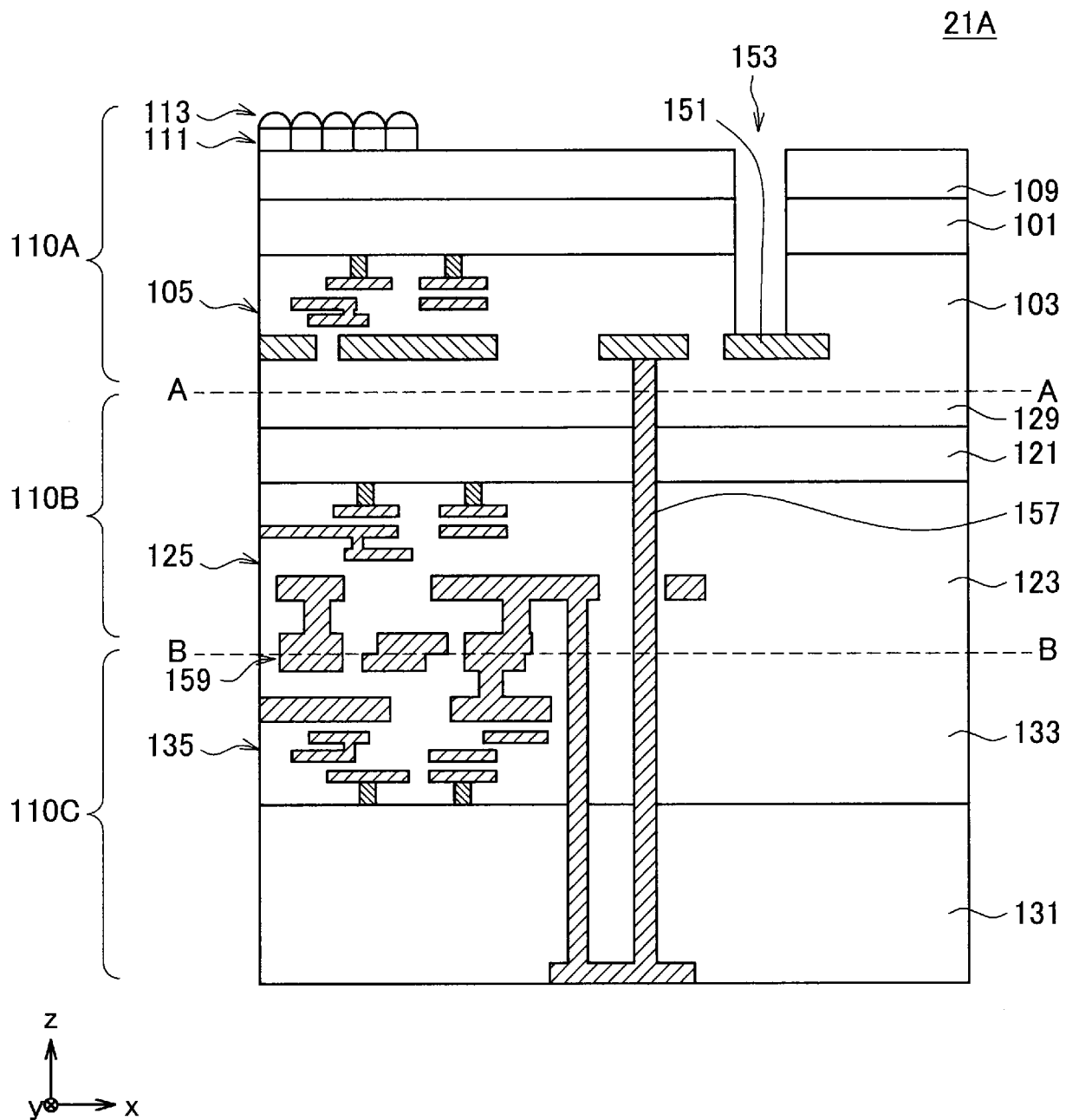
[図20D]



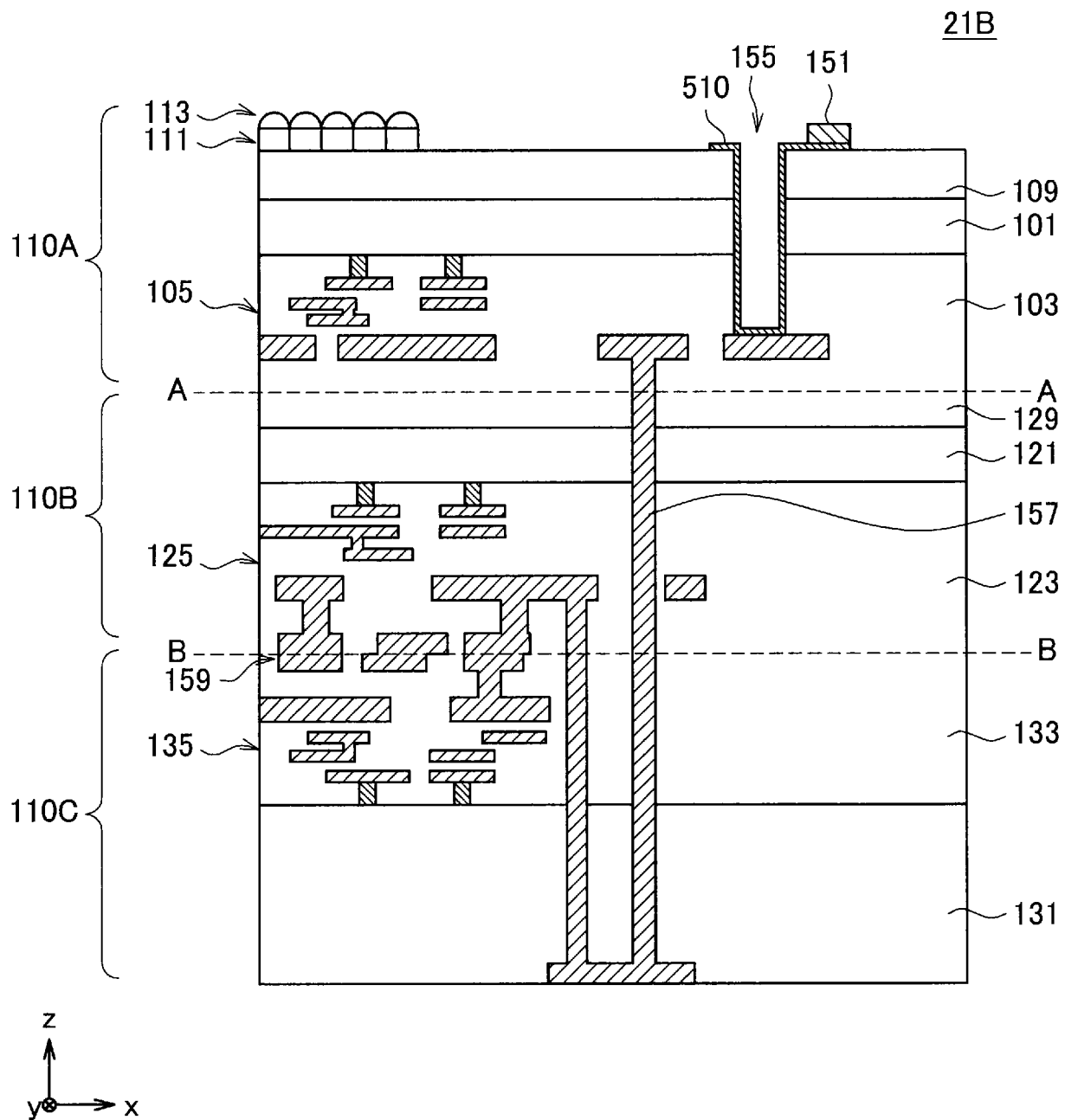
[図20E]



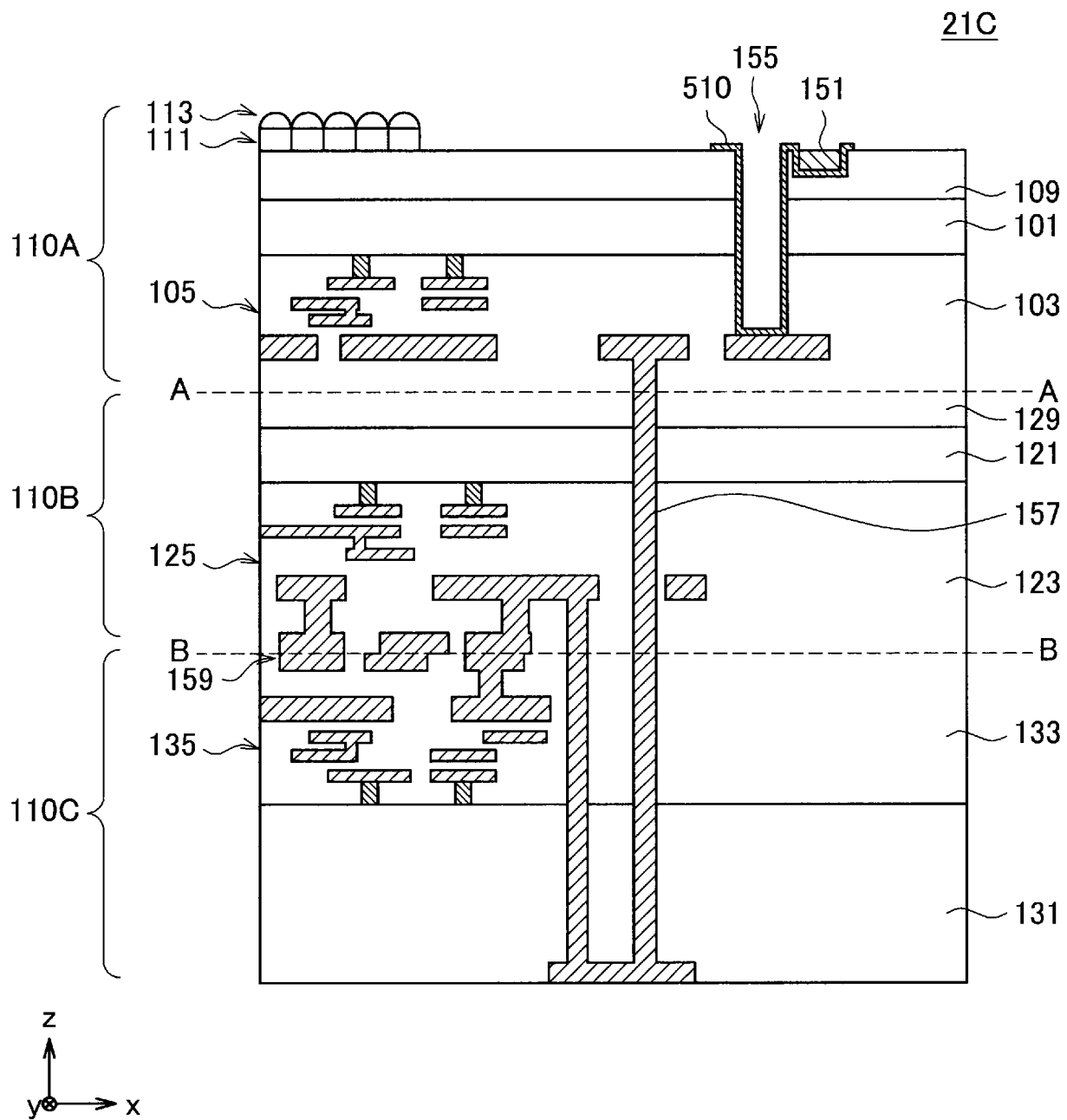
[図21A]



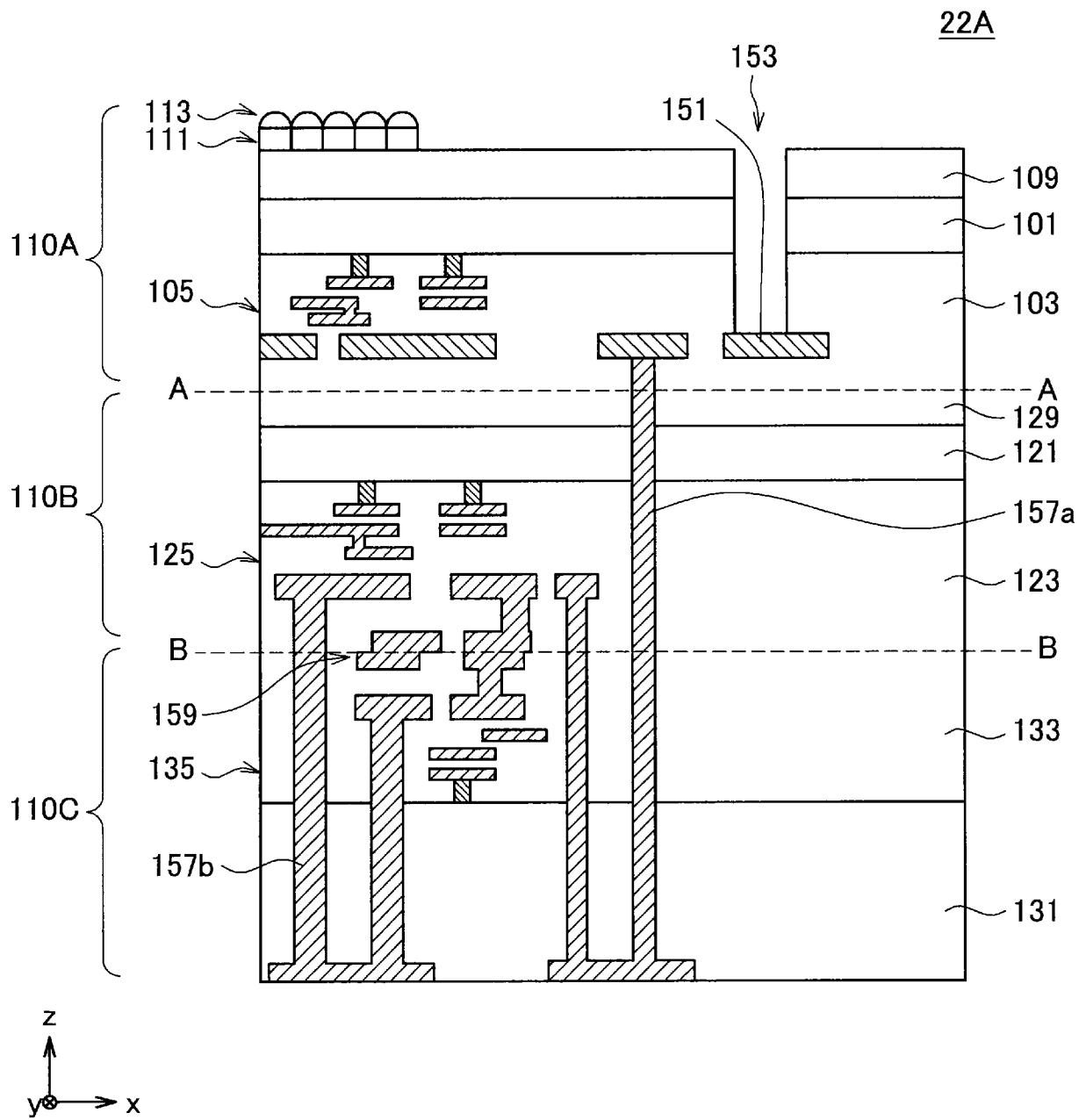
[図21B]



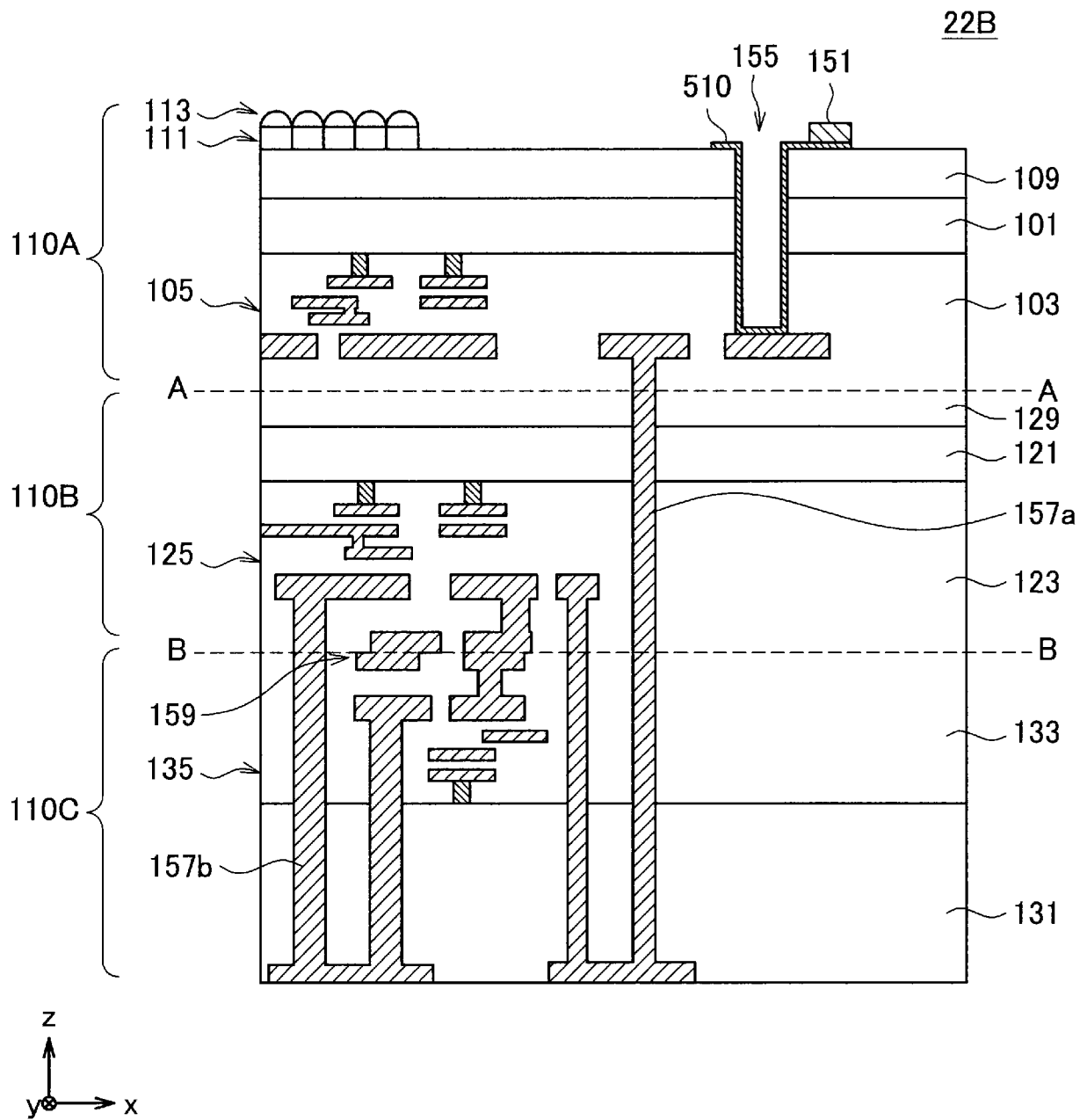
[図21C]



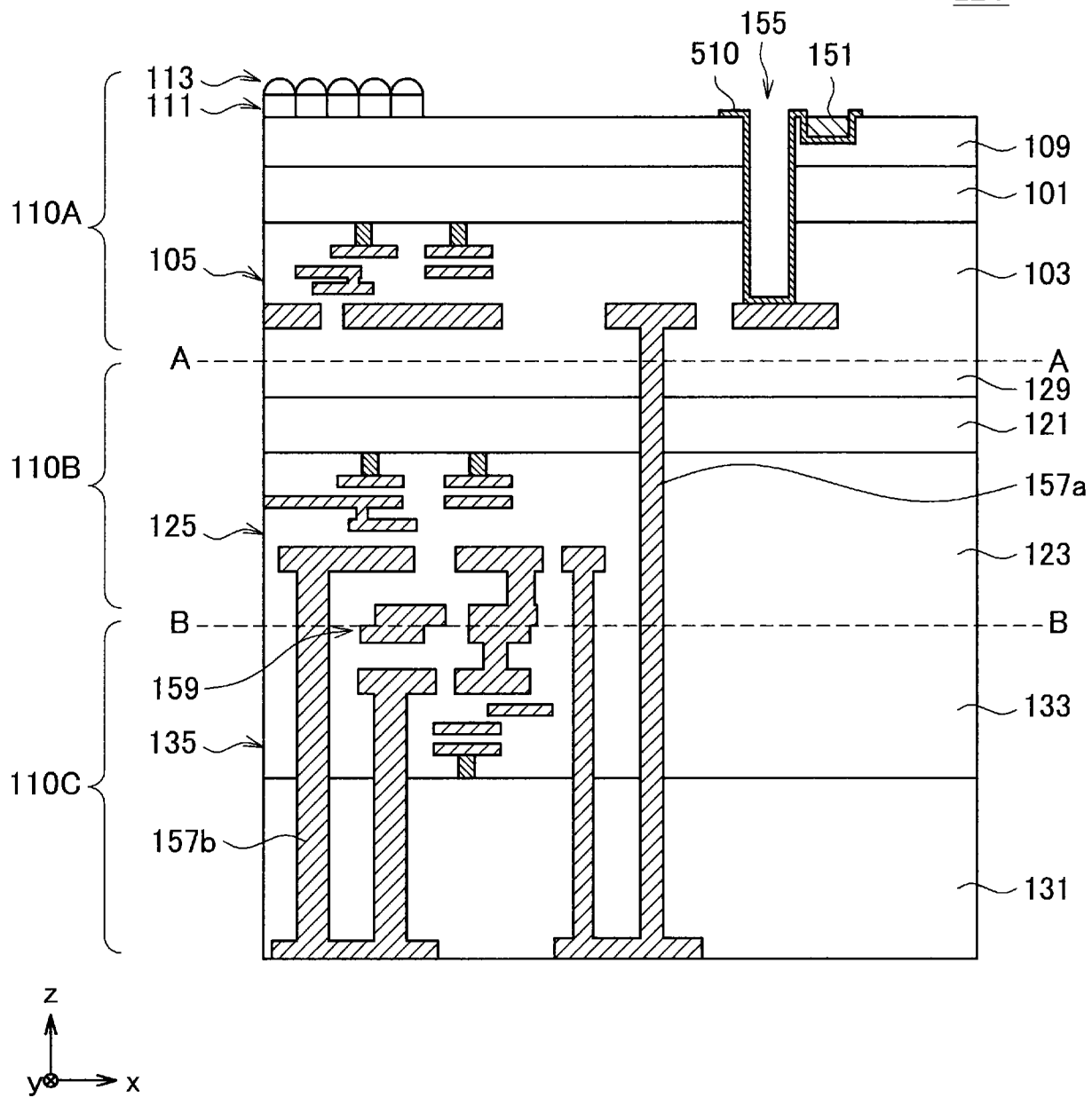
[図22A]



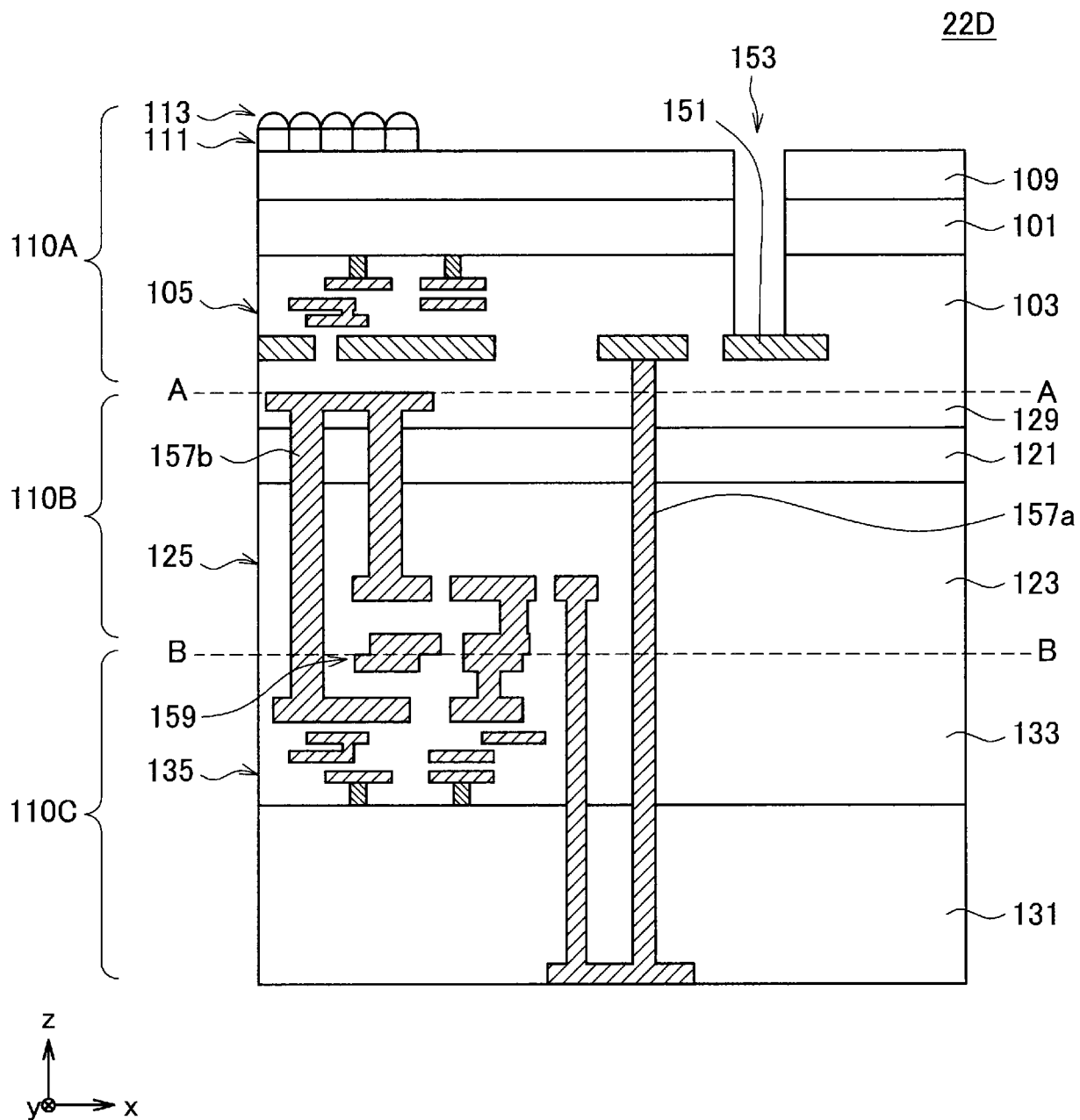
[図22B]



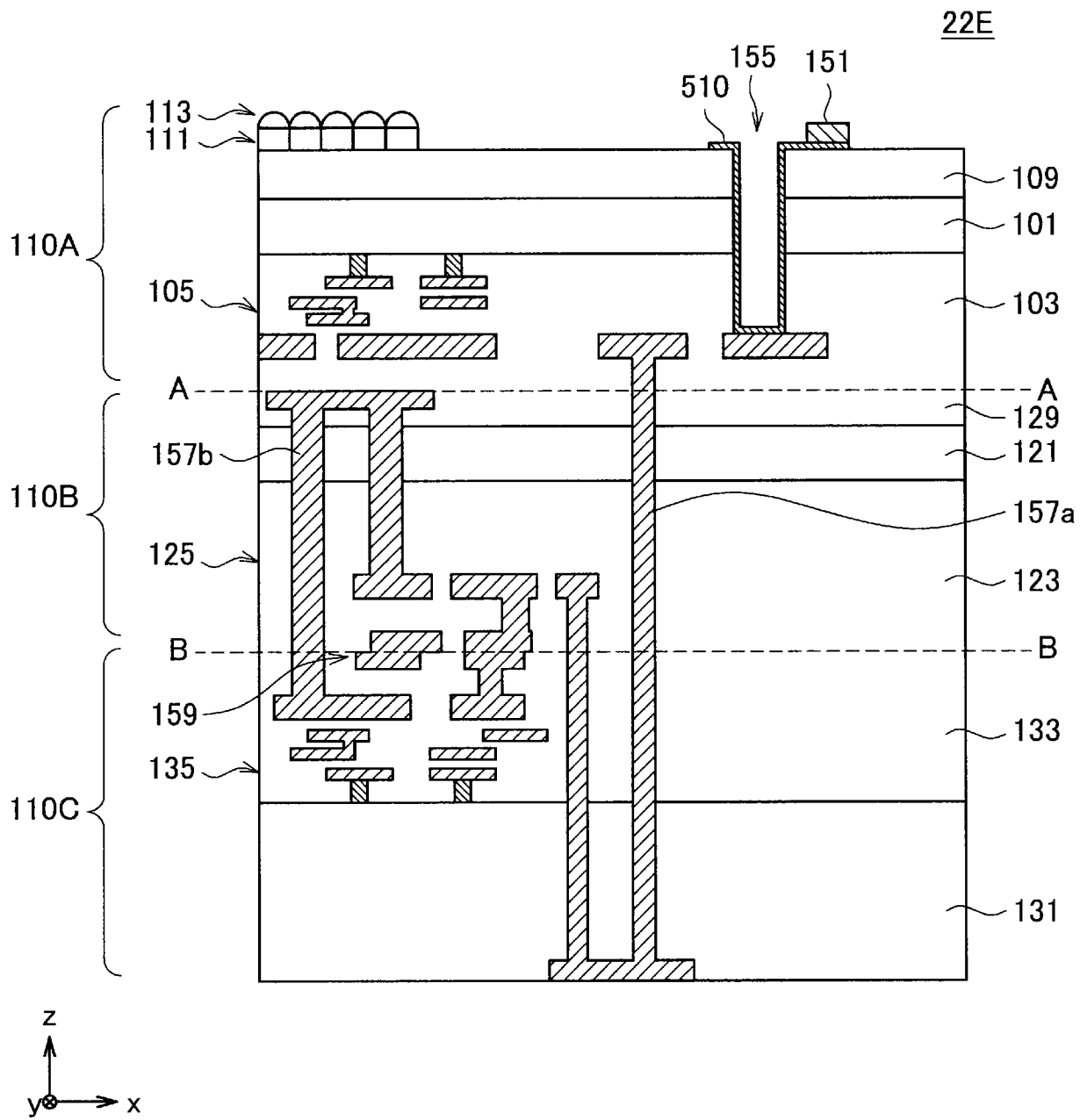
[図22C]

22C

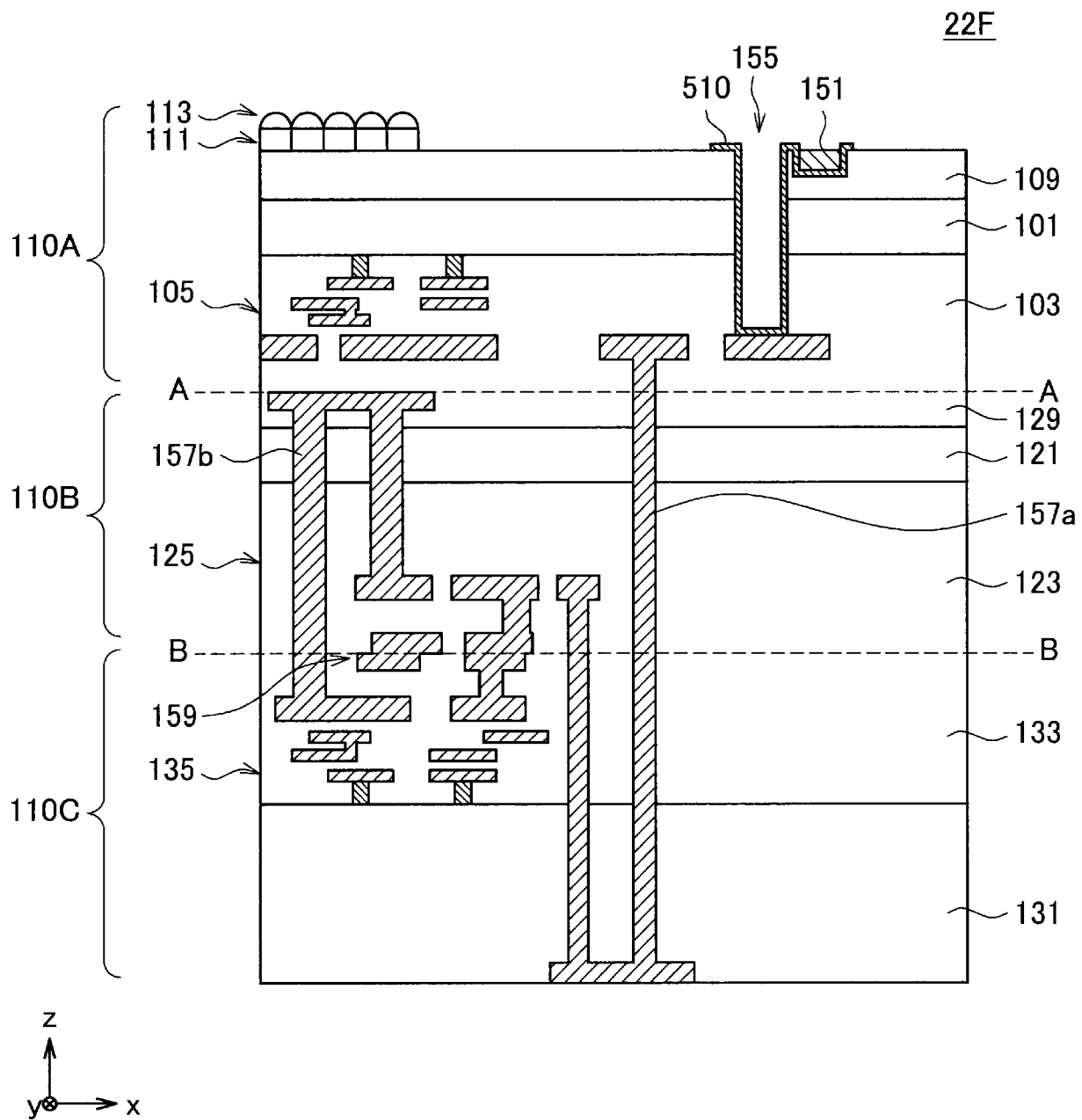
[図22D]



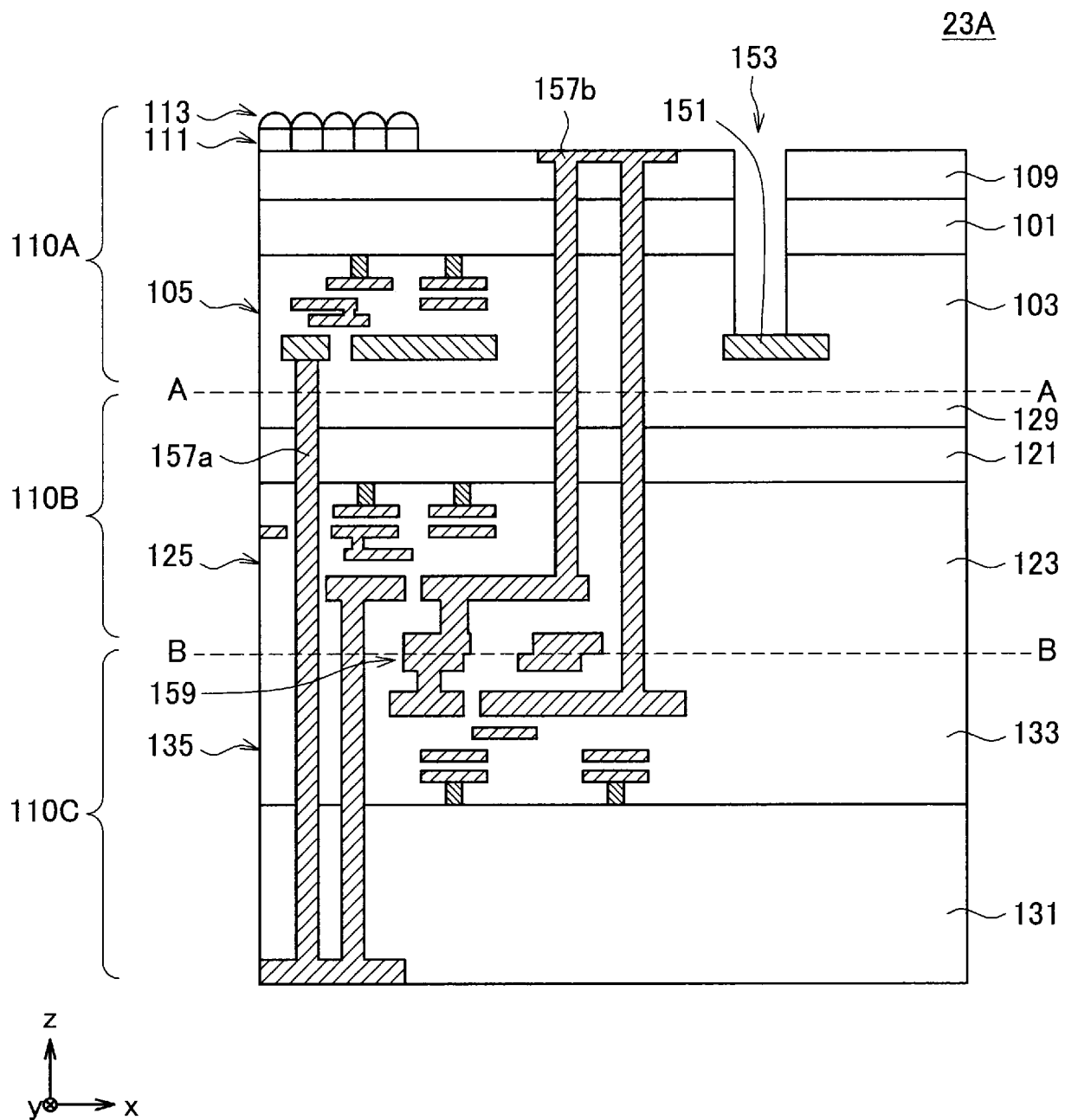
[図22E]



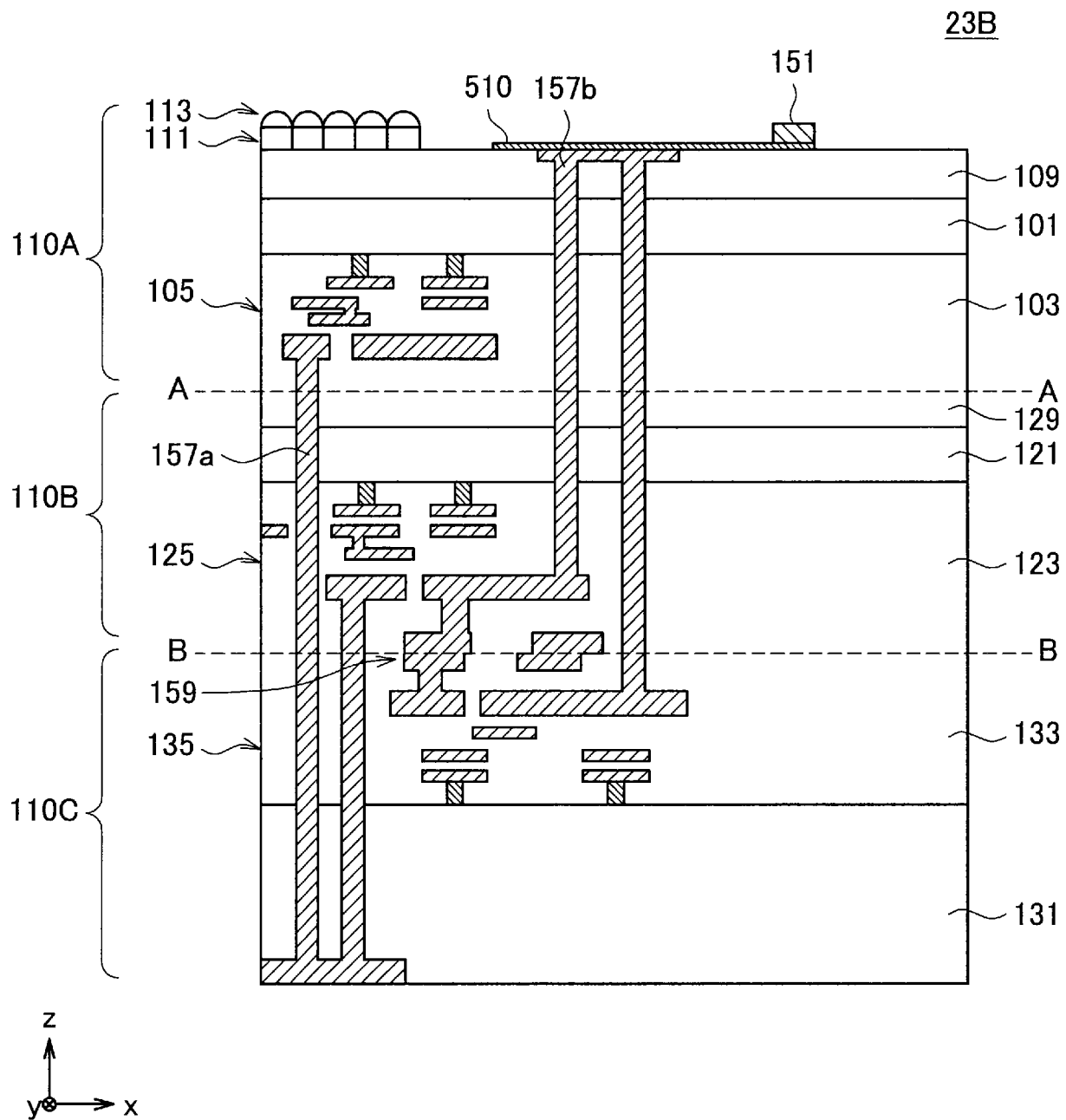
[図22F]



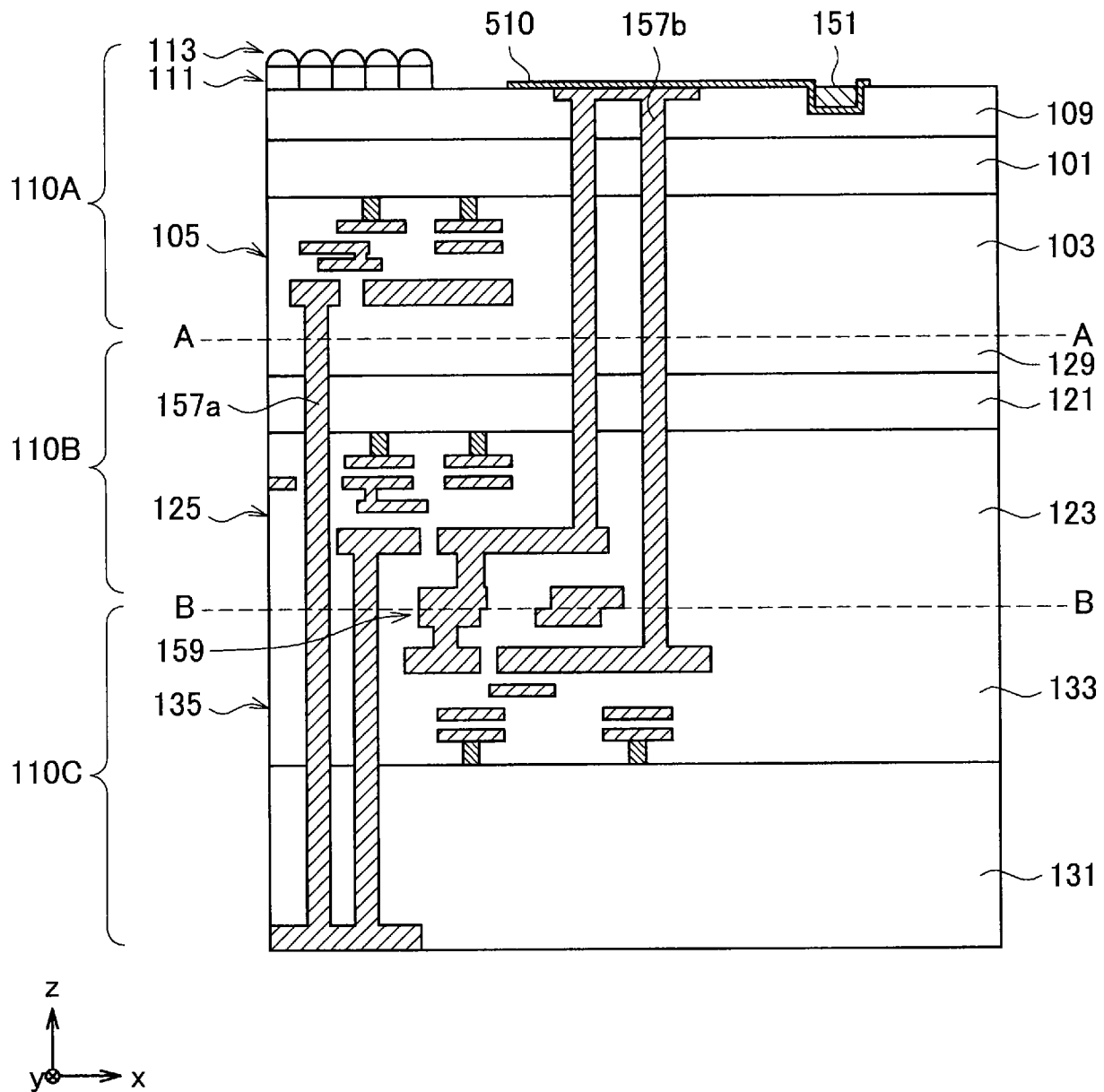
[図23A]



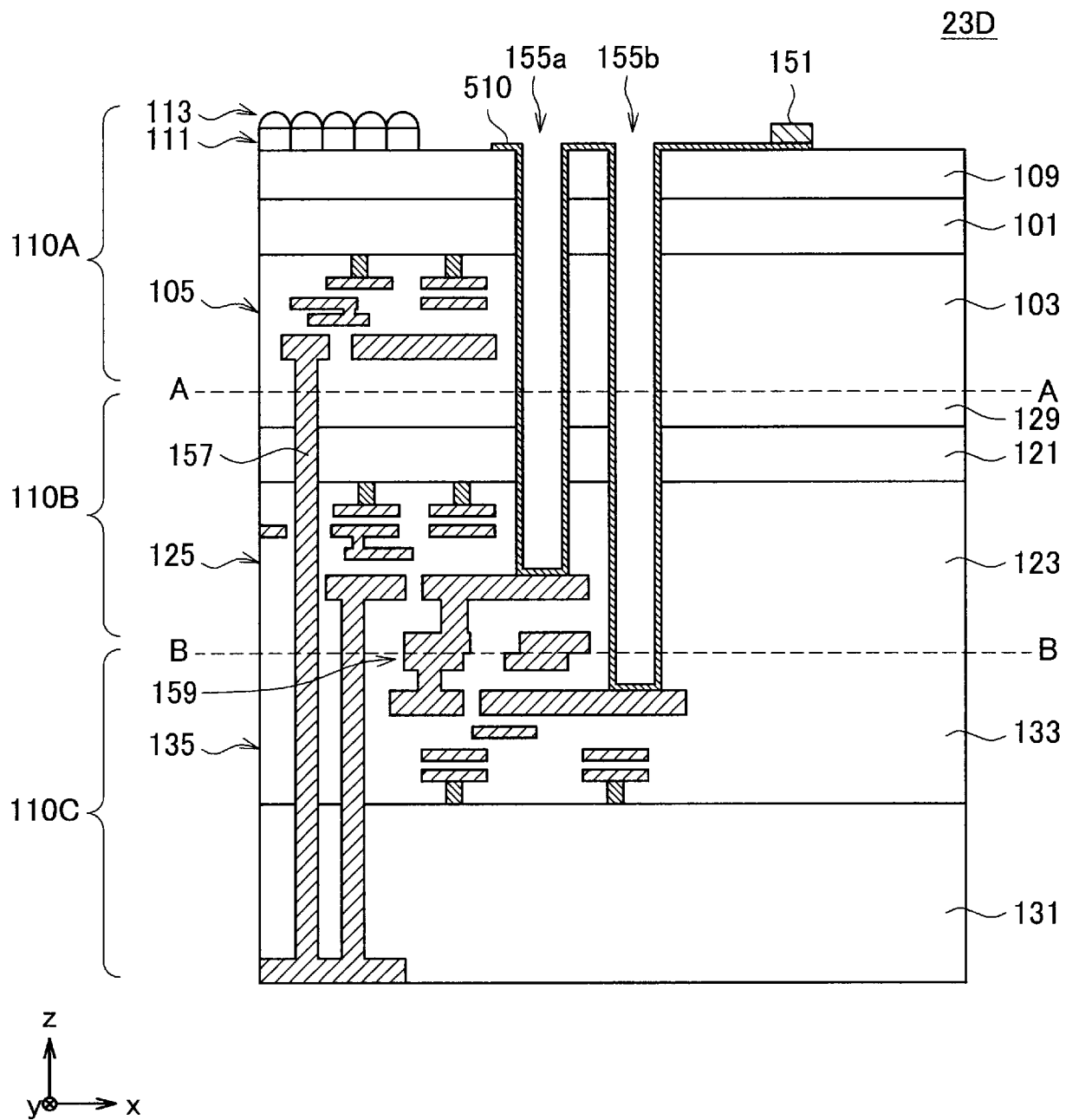
[図23B]



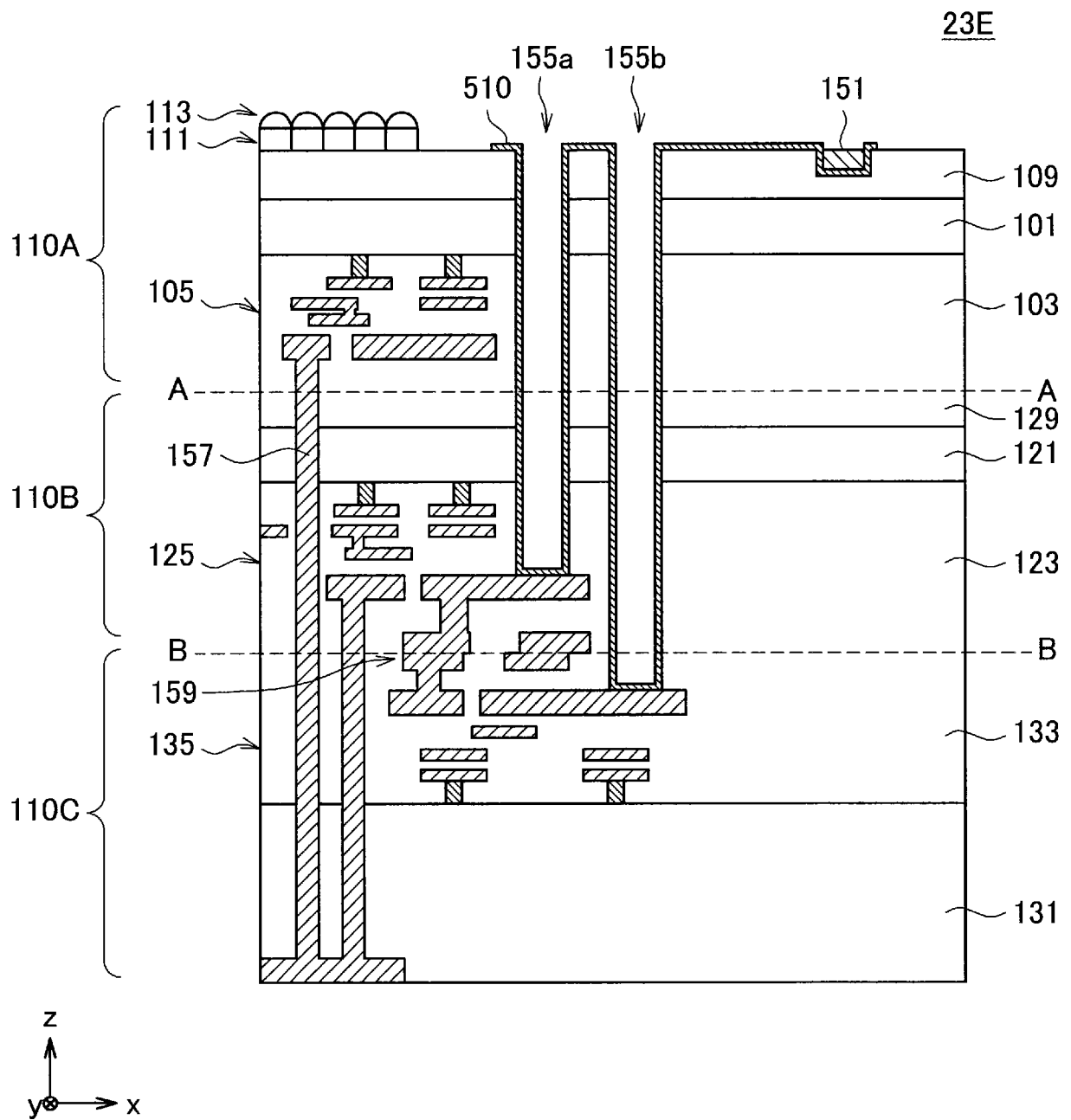
[図23C]

23C

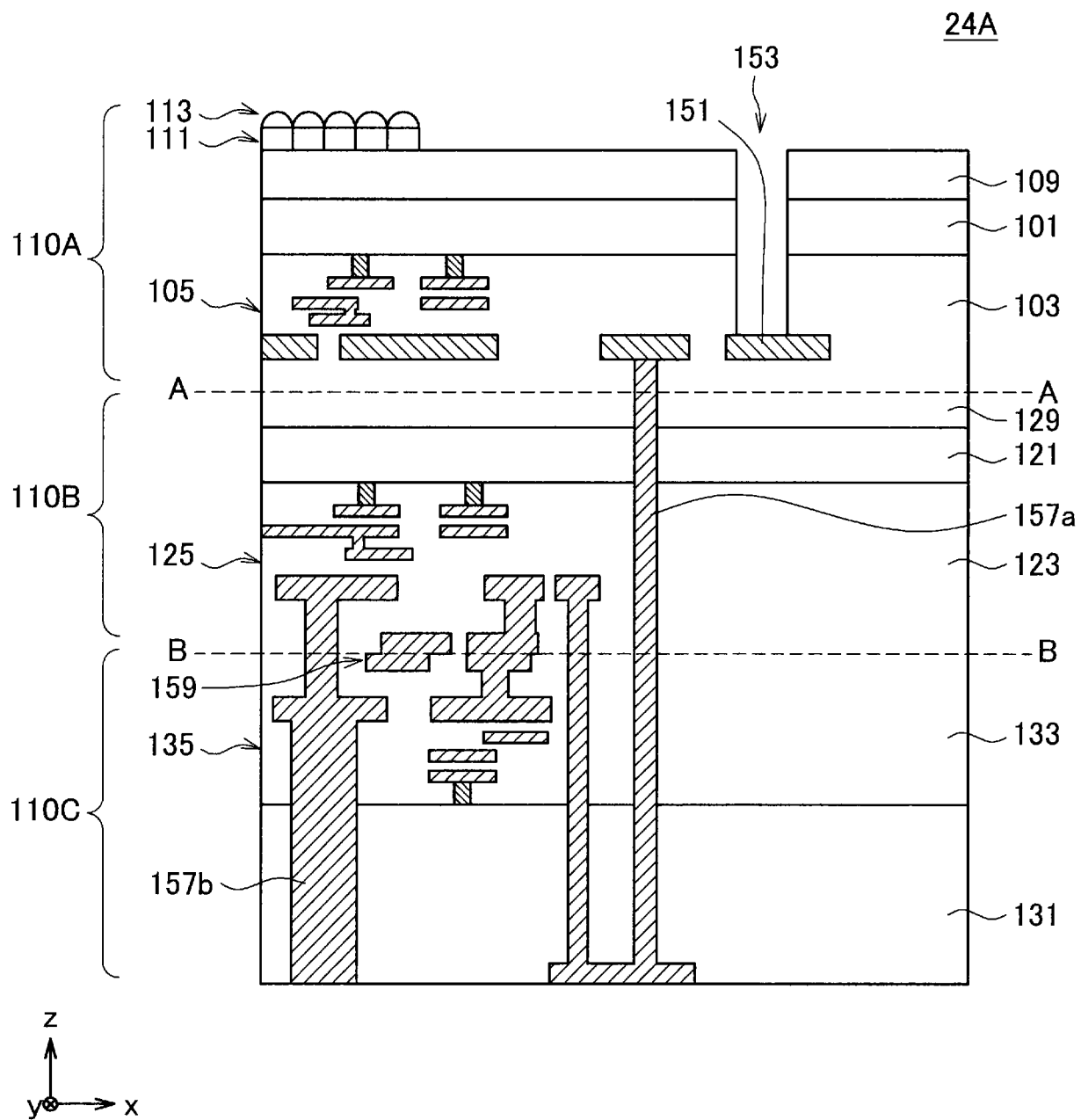
[図23D]



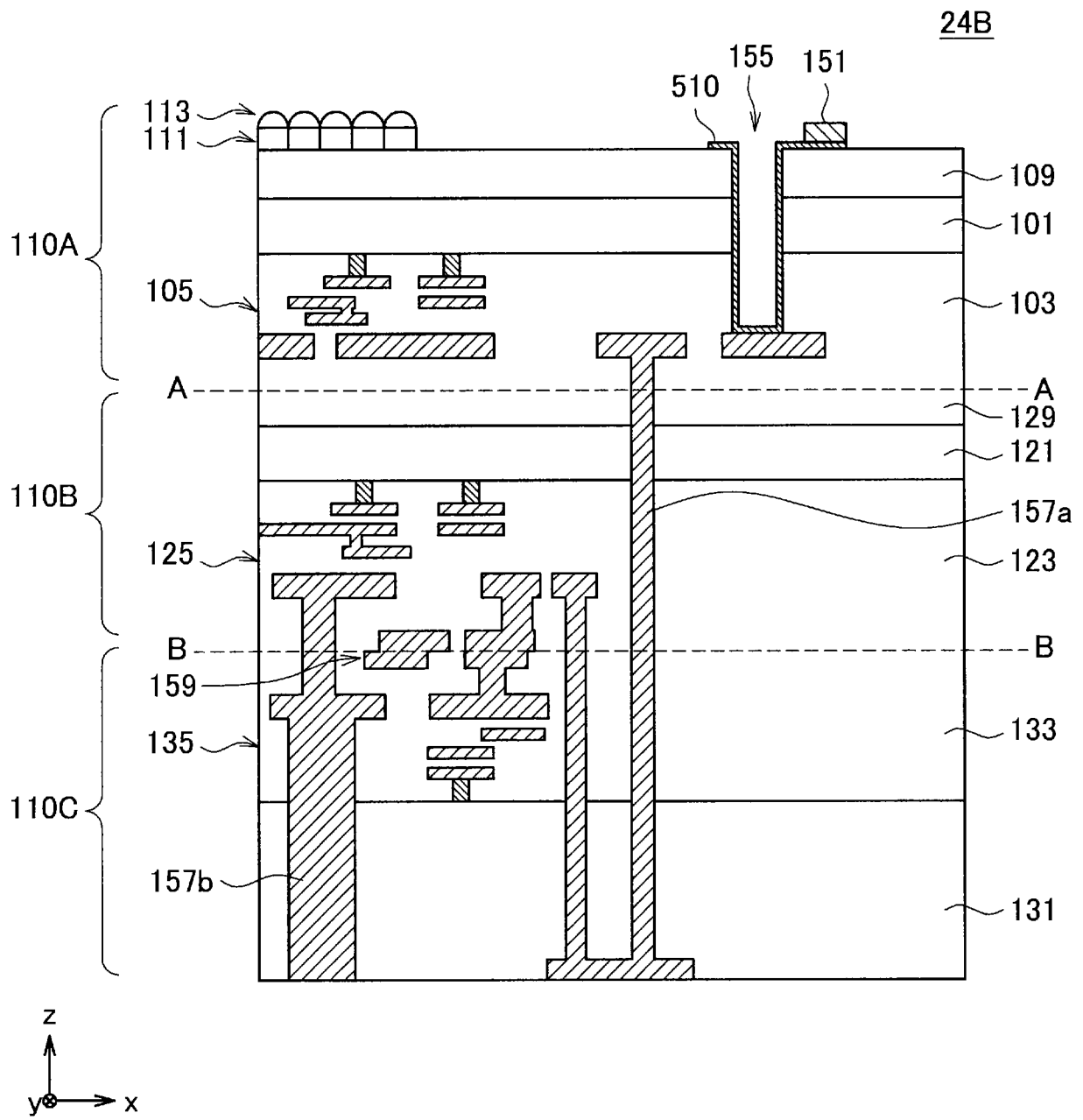
[図23E]



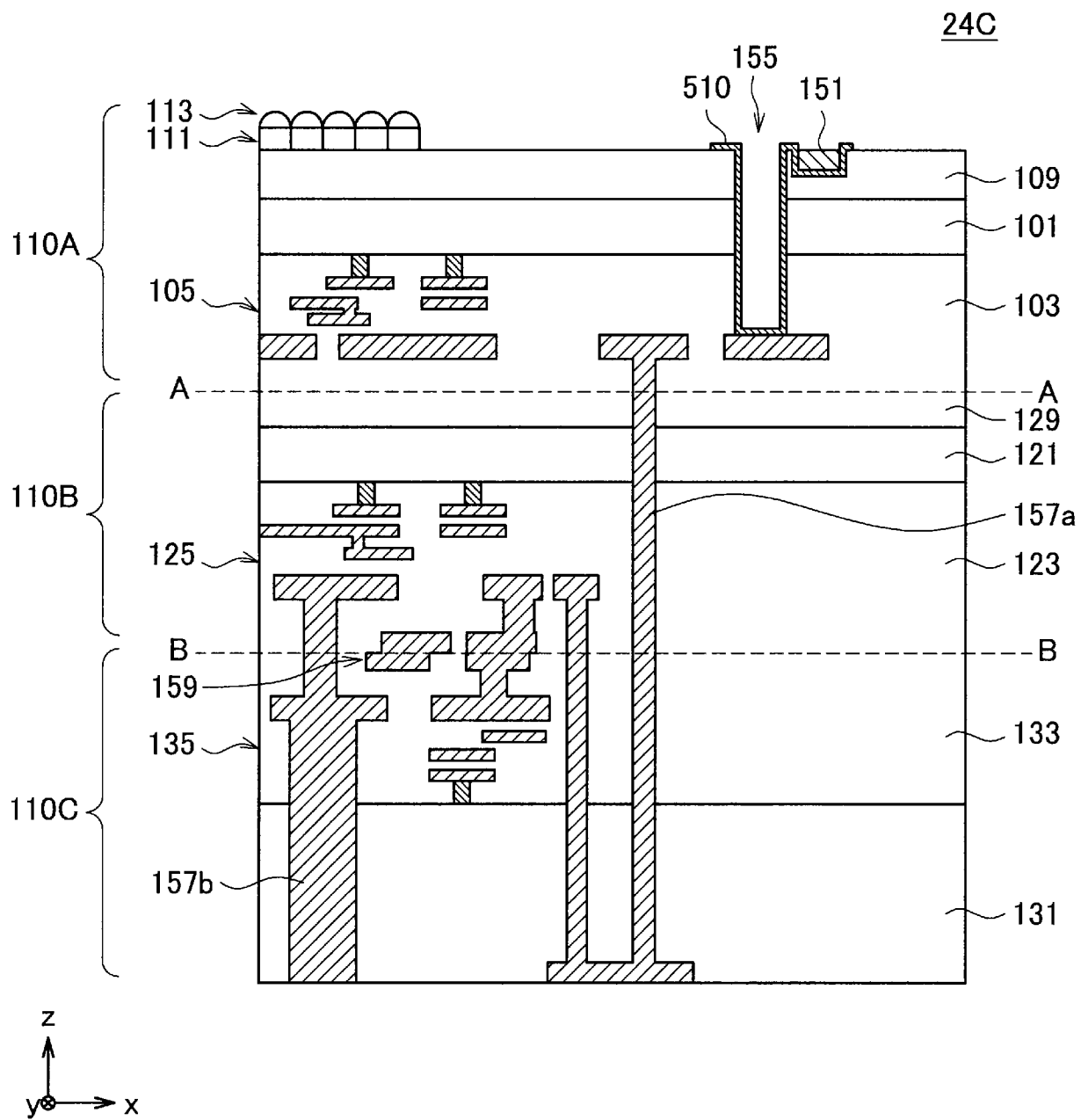
[図24A]



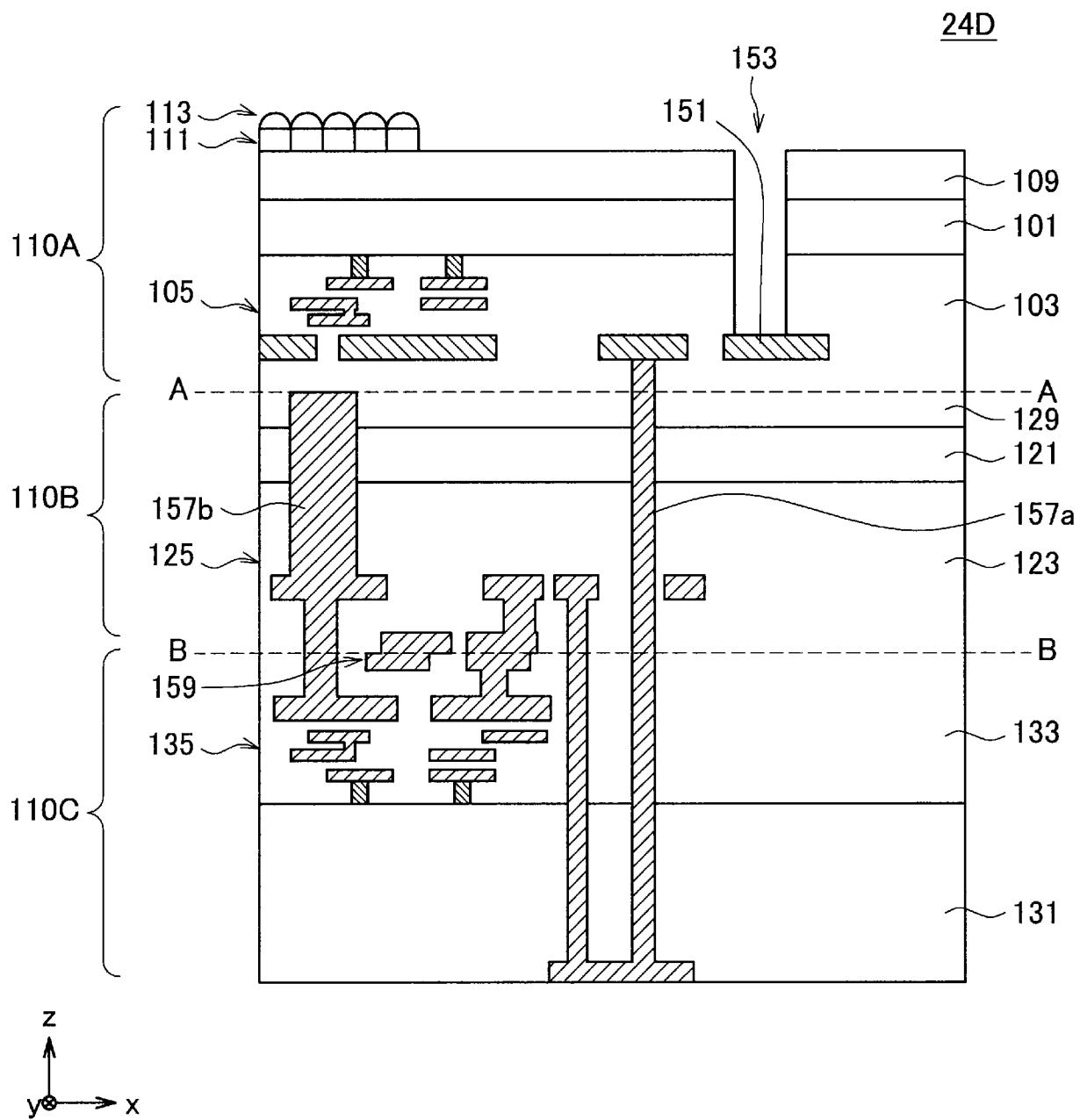
[図24B]



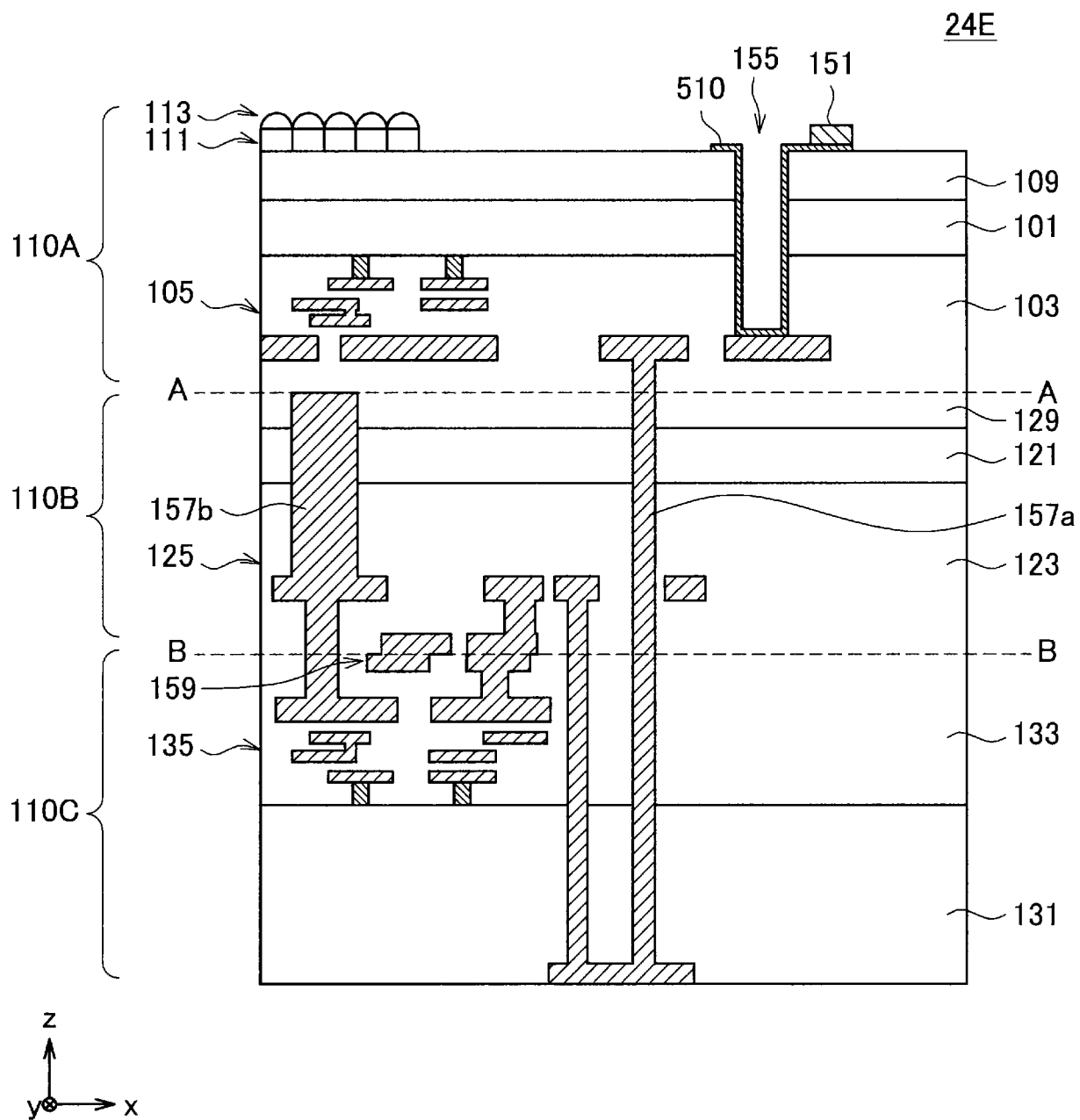
[図24C]



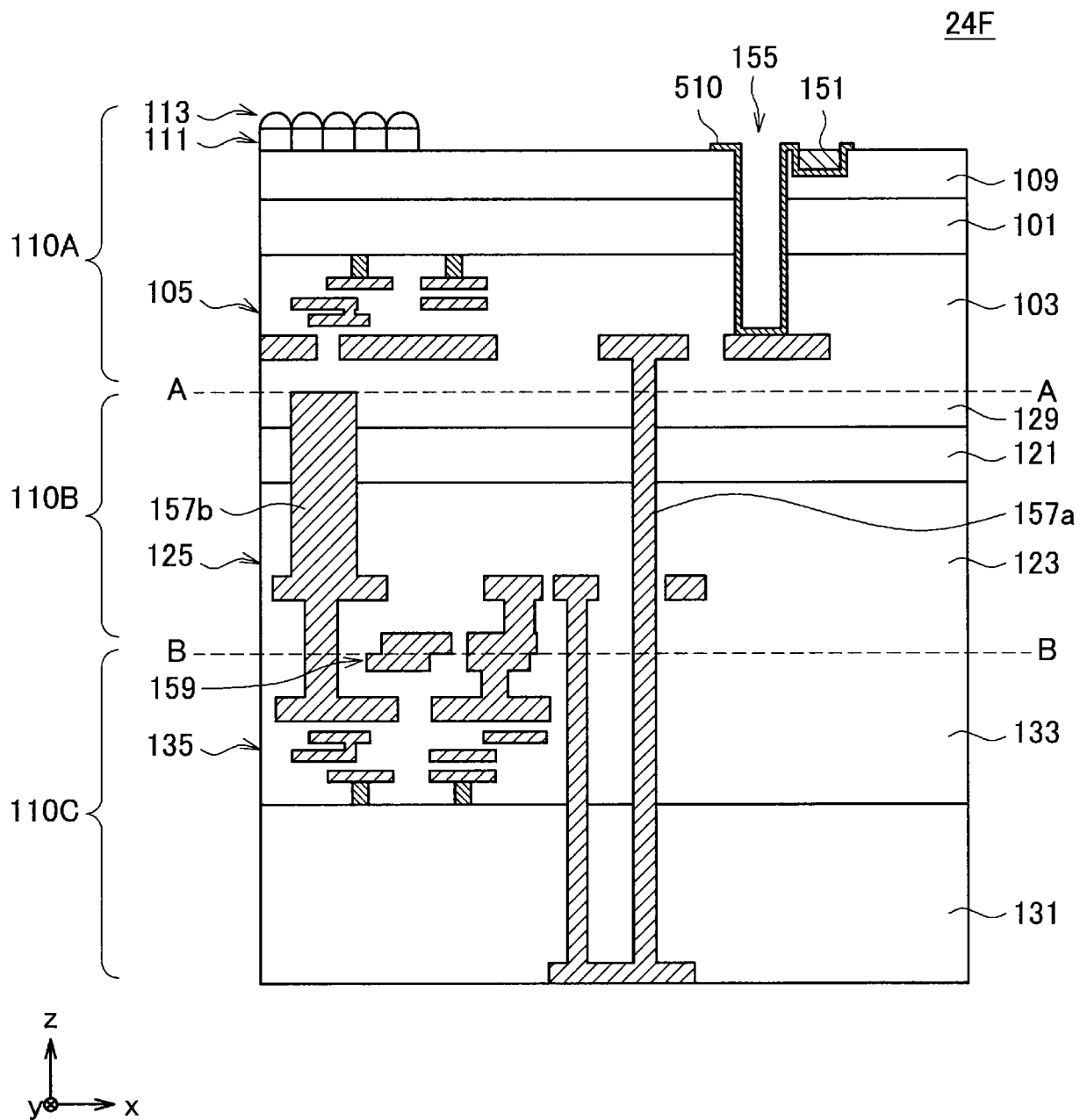
[図24D]



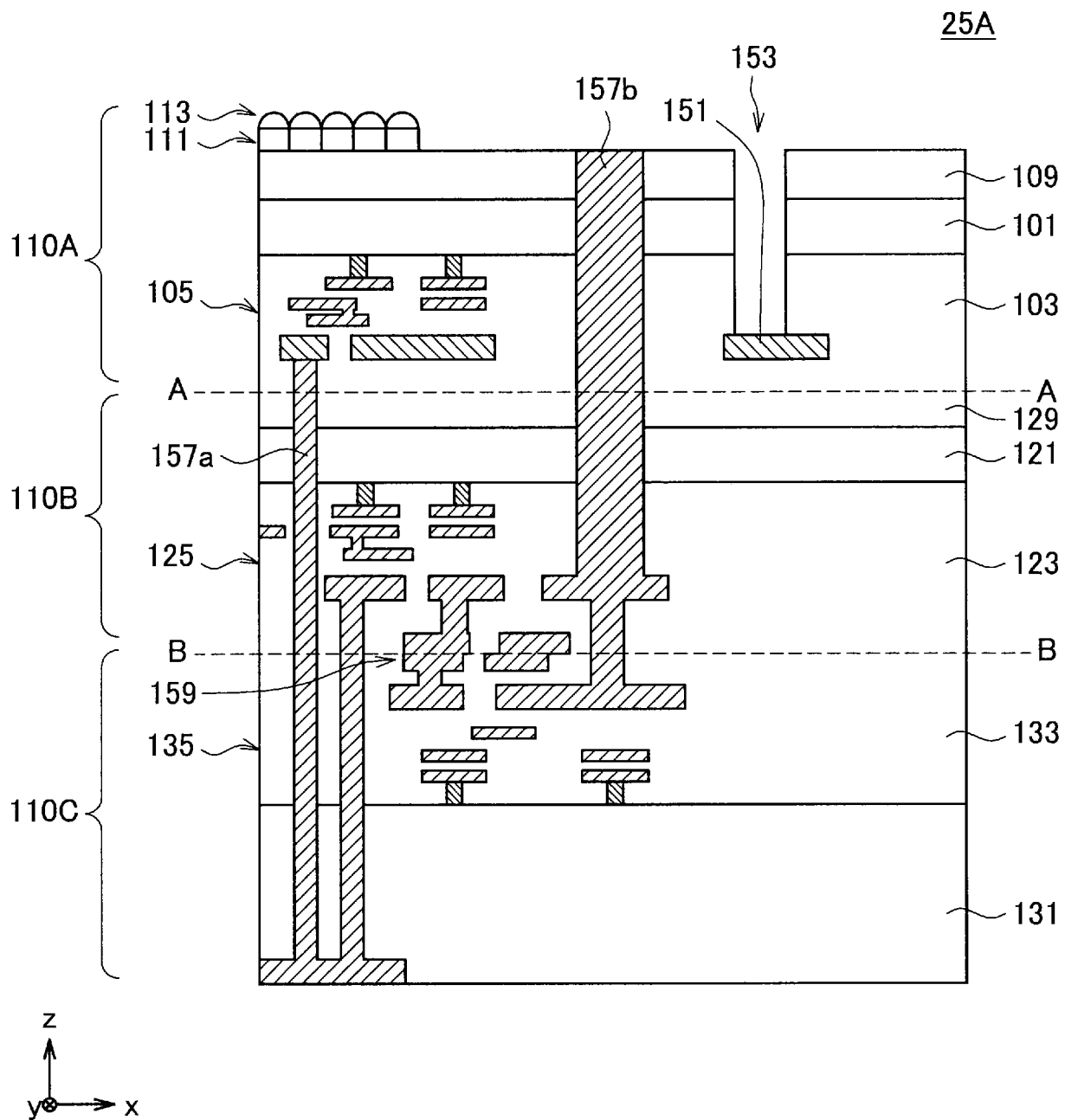
[図24E]



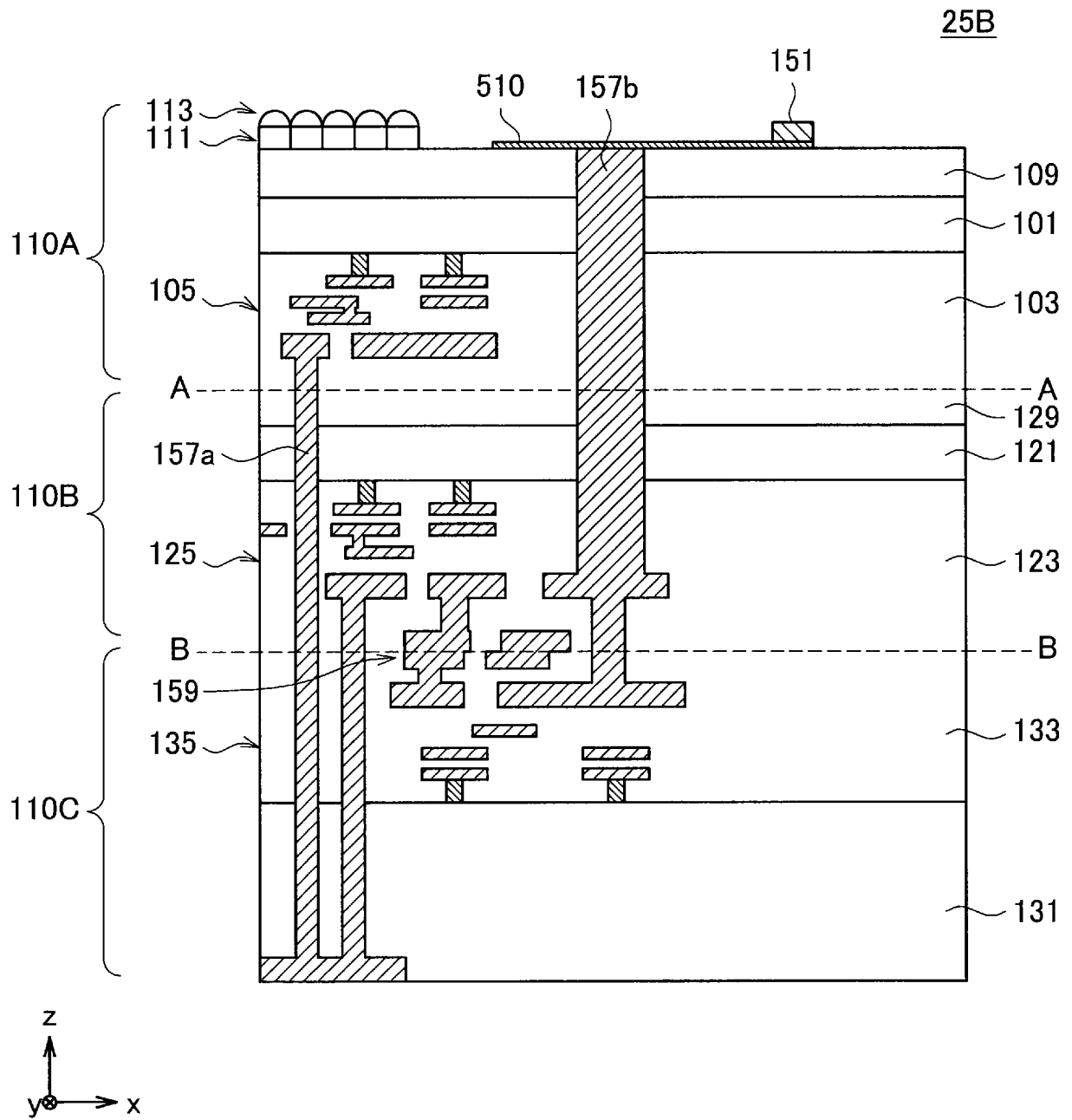
[図24F]



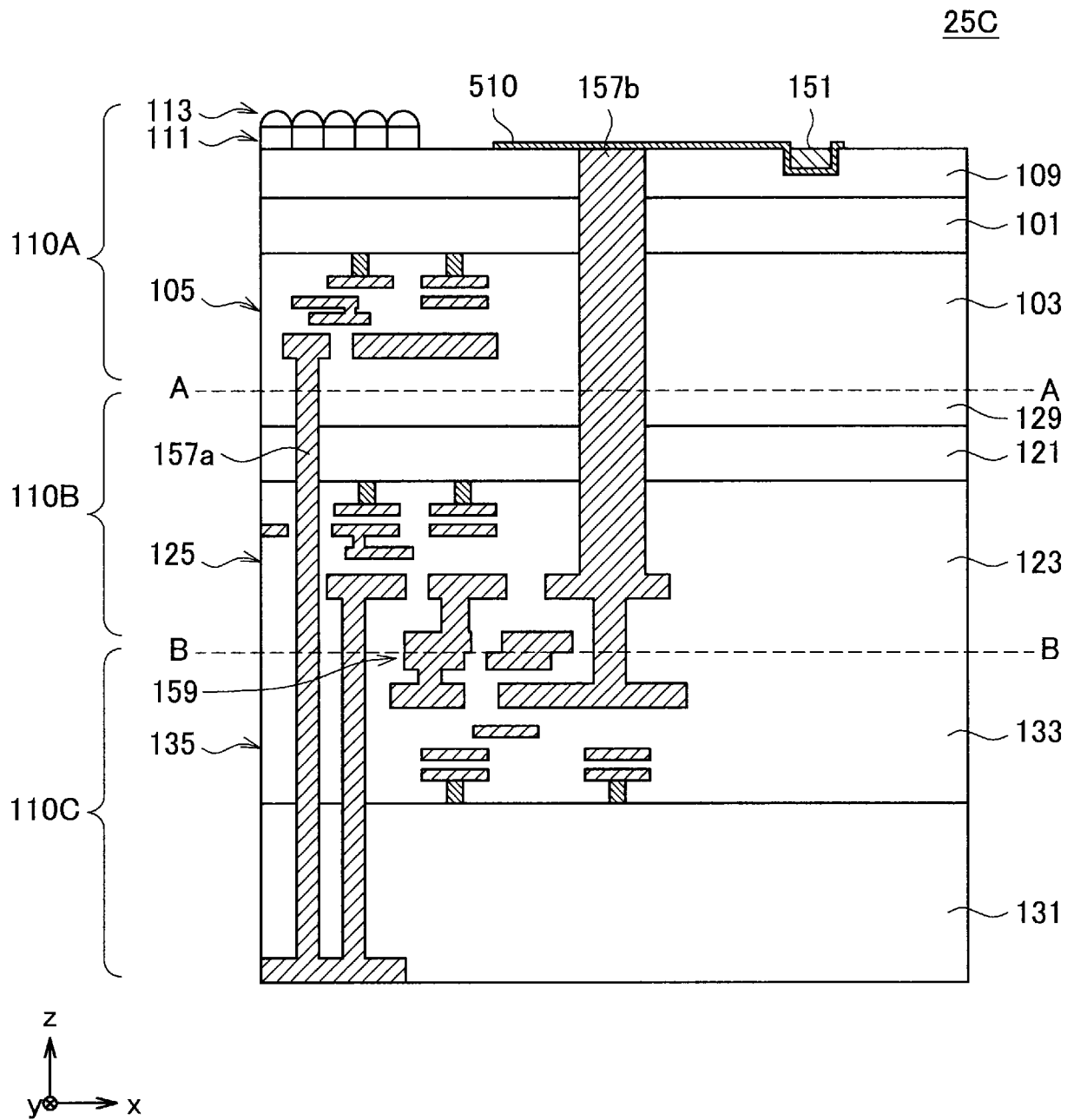
[図25A]



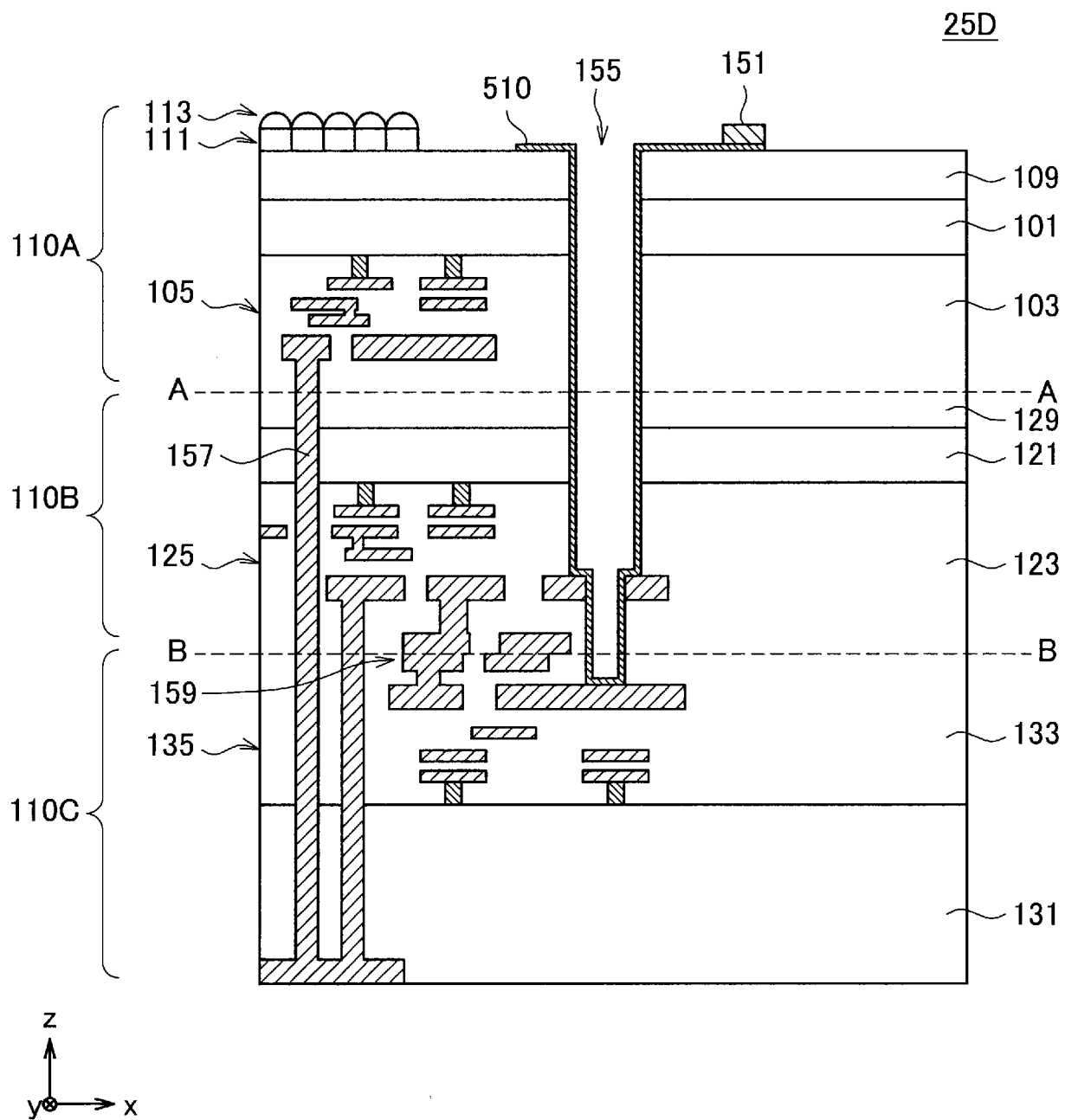
[図25B]



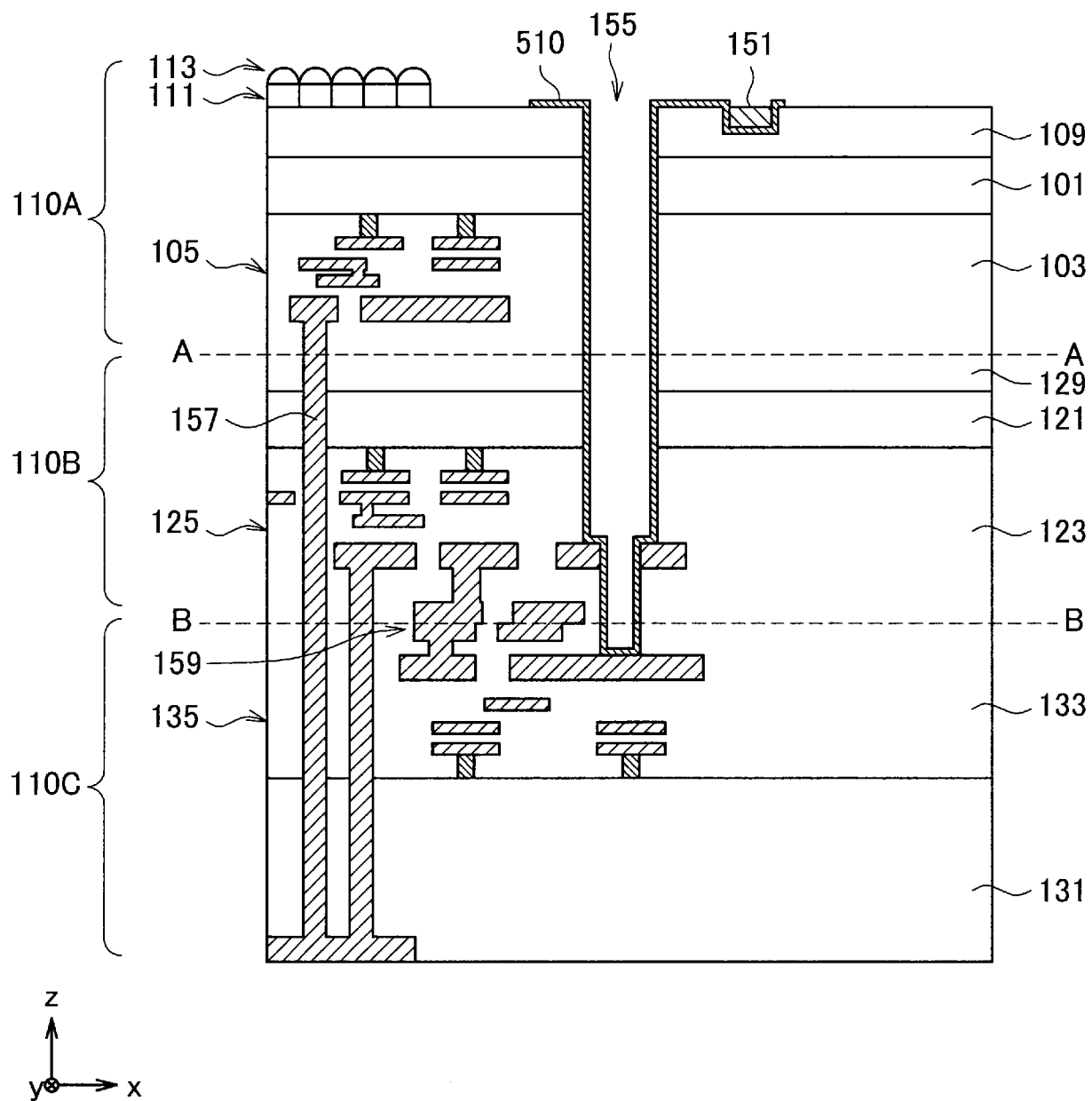
[図25C]



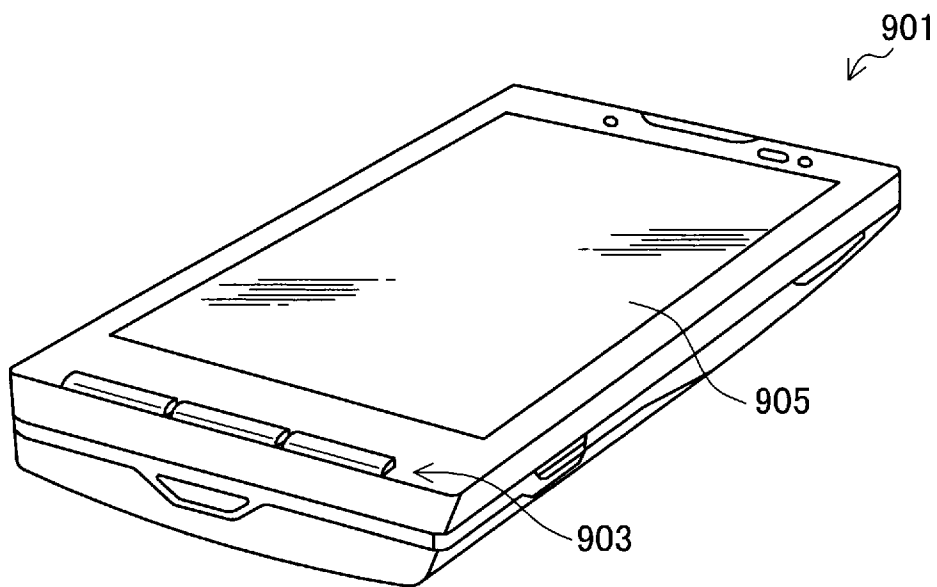
[図25D]



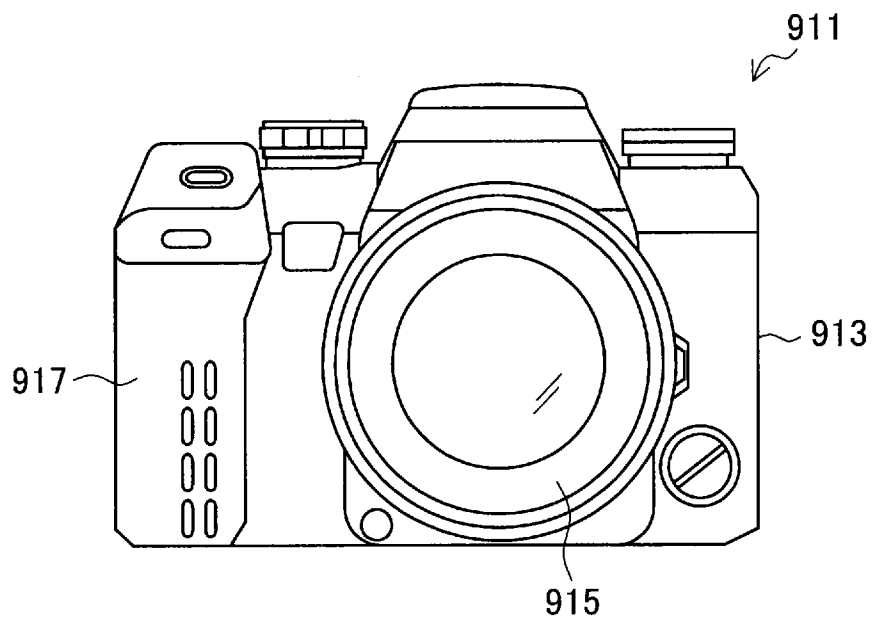
[図25E]

25E

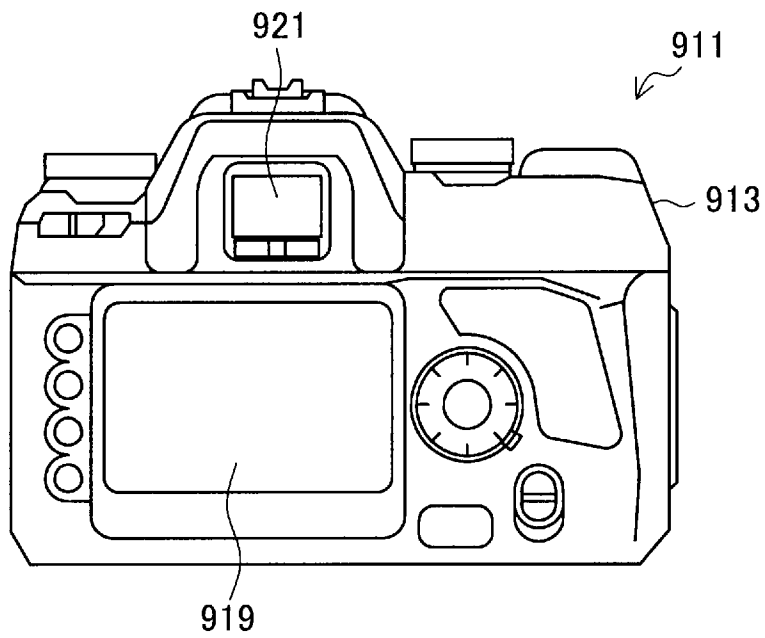
[図26A]



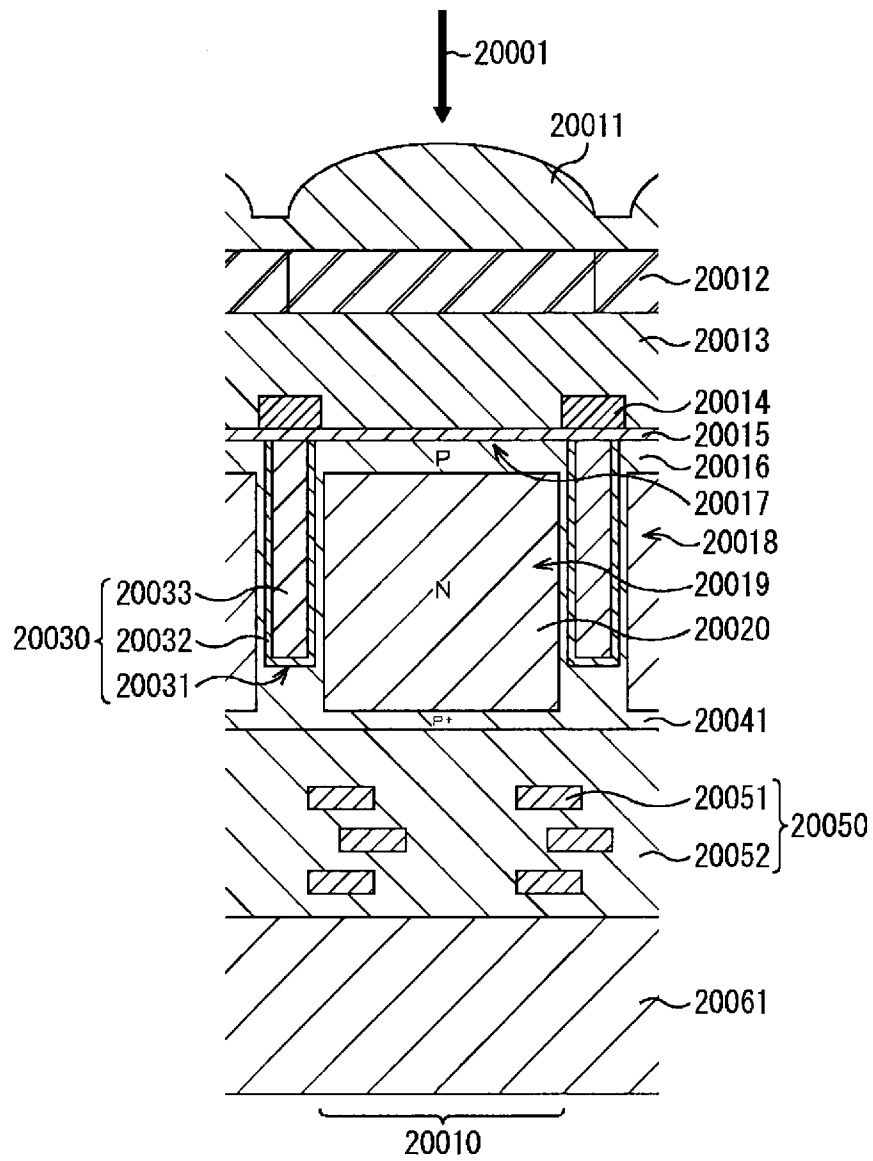
[図26B]



[図26C]

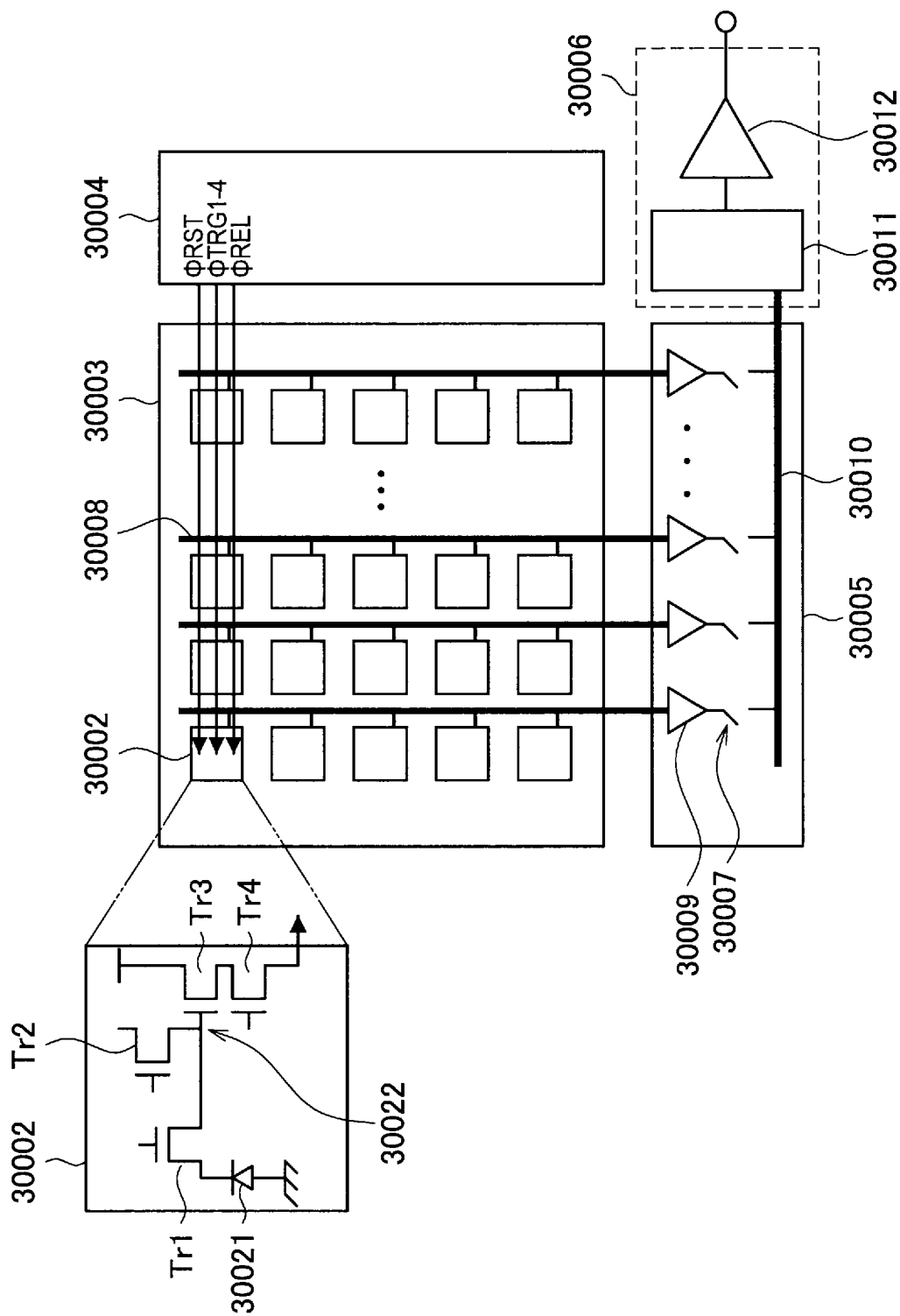


[図27A]



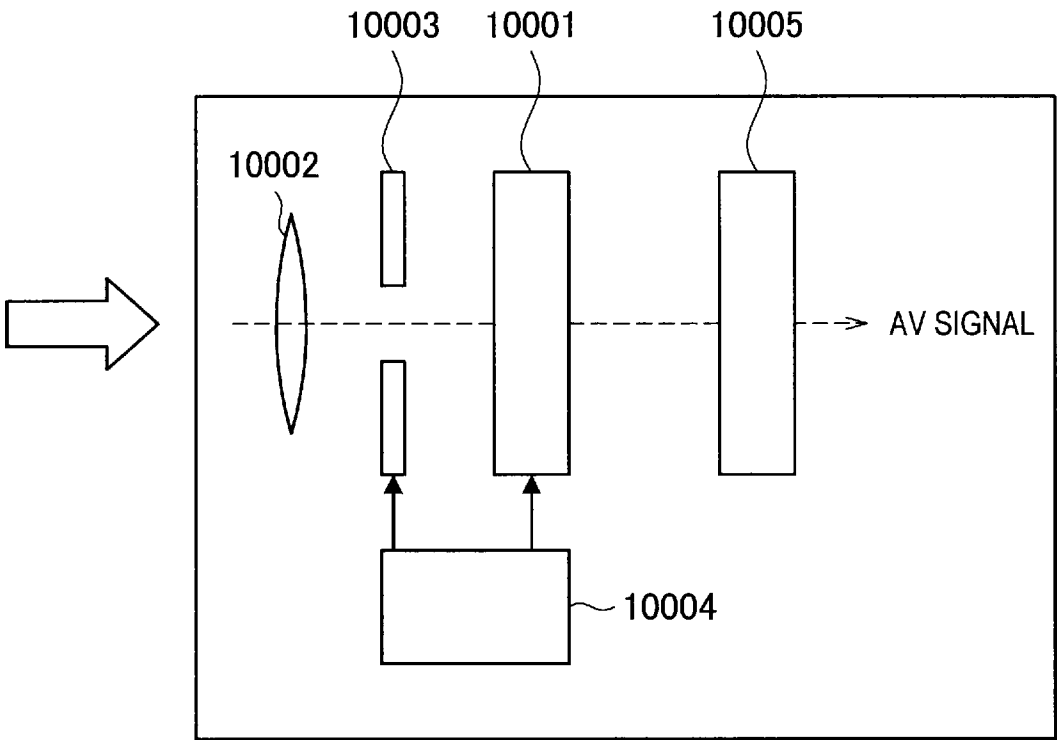
[図27B]

30001

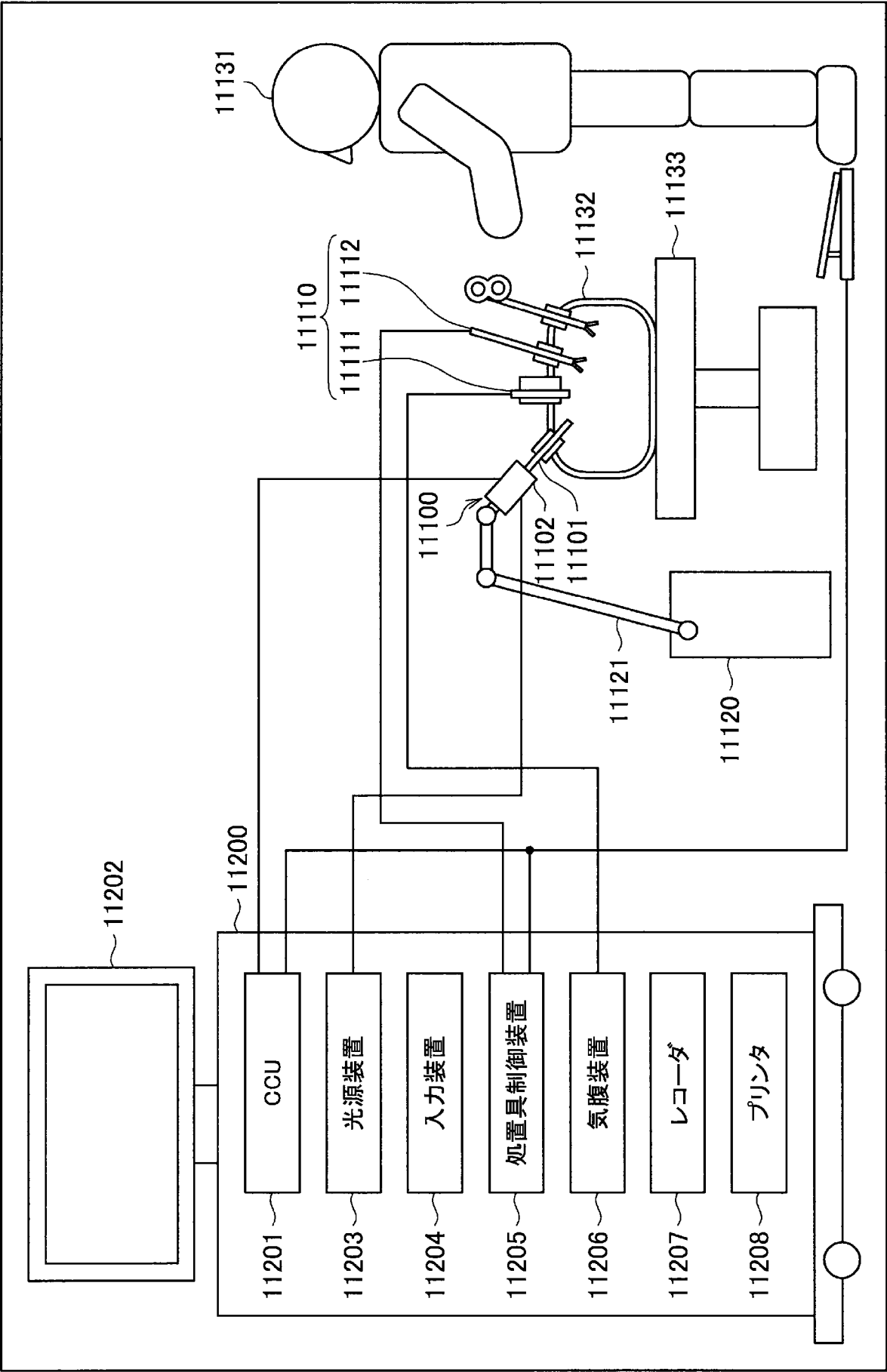


[図27C]

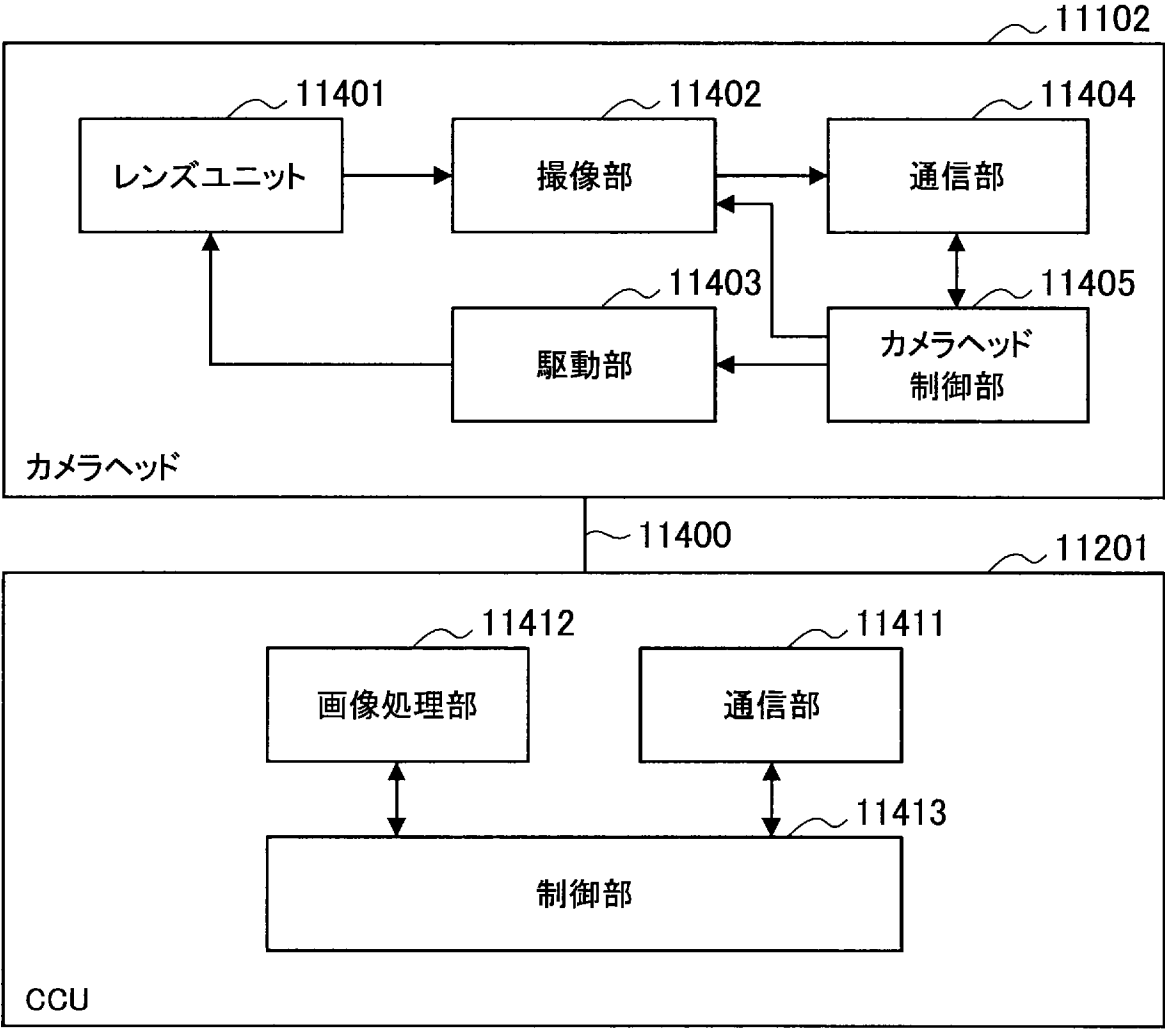
10000



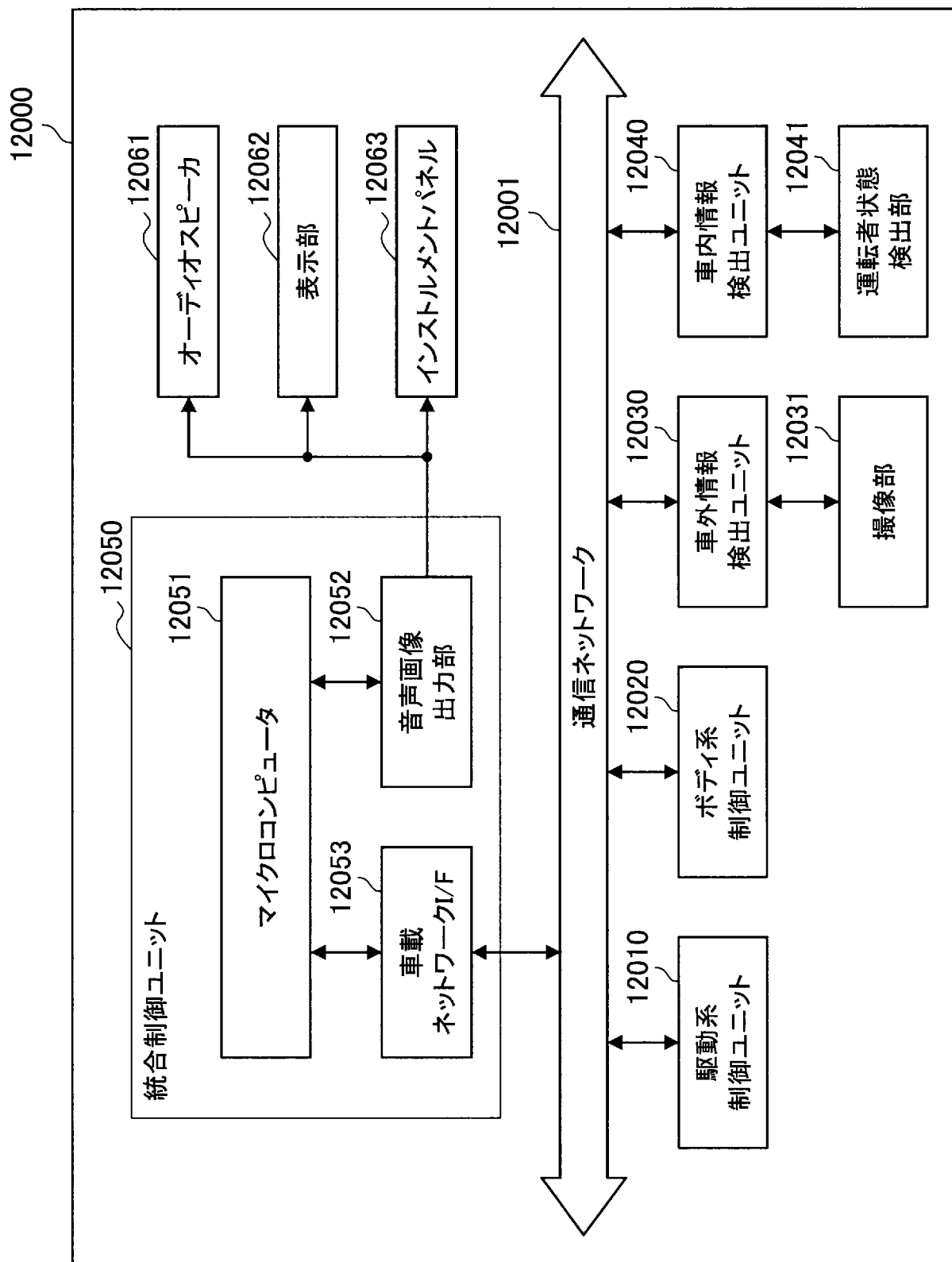
[図27D]



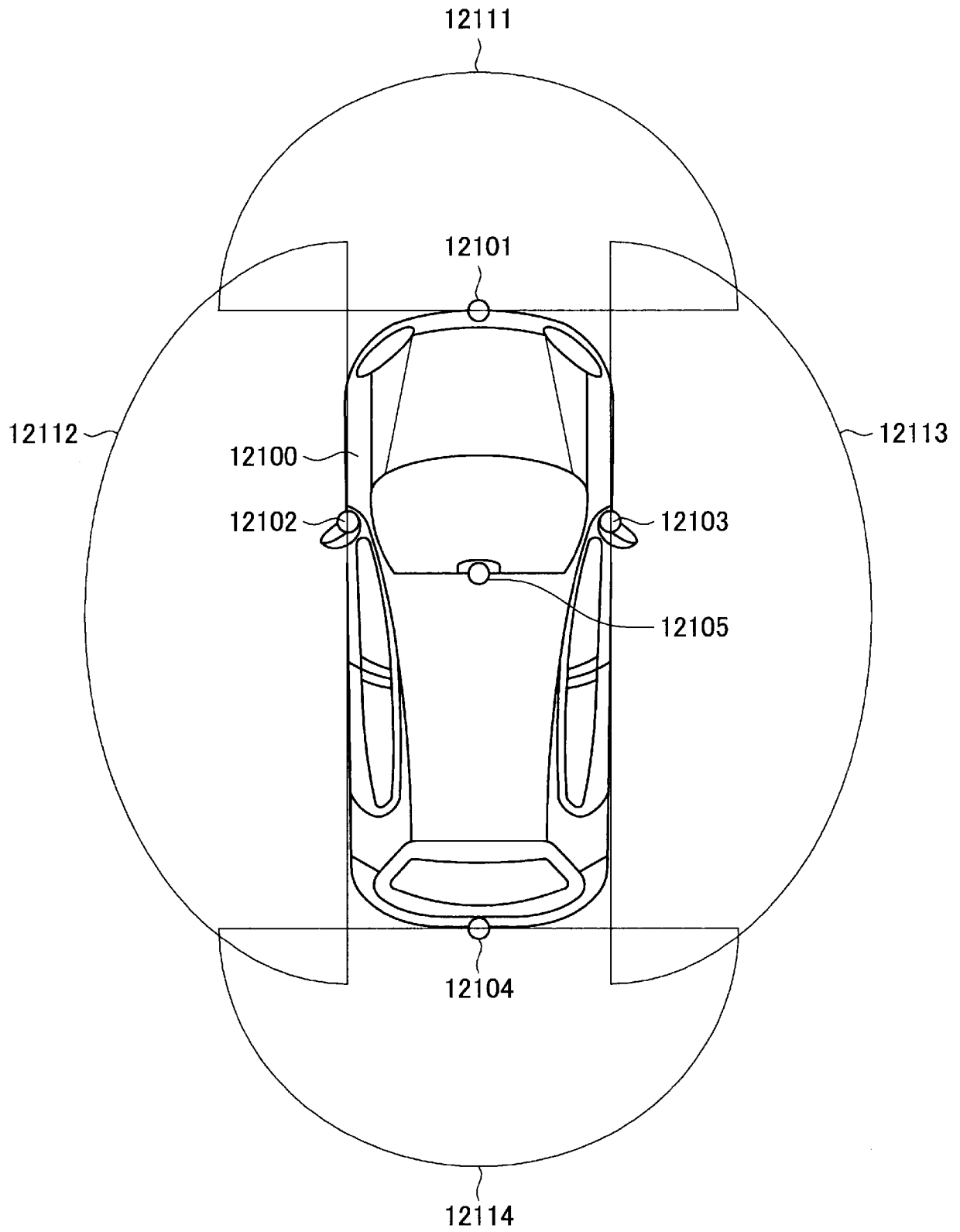
[図27E]



[図27F]



[図27G]



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2018/011567

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

Int.Cl. H01L27/146(2006.01)i, H01L21/02(2006.01)i, H01L21/3205(2006.01)i, H01L21/768(2006.01)i H01L23/522(2006.01)i, H01L25/065(2006.01)i, H01L25/07(2006.01)i, H01L25/18(2006.01)i, H04N5/369(2011.01)i
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int.Cl. H01L27/146, H01L21/02, H01L21/3205, H01L21/768, H01L23/522, H01L25/065, H01L25/07, H01L25/18, H04N5/369

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Published examined utility model applications of Japan	1922-1996
Published unexamined utility model applications of Japan	1971-2018
Registered utility model specifications of Japan	1996-2018
Published registered utility model applications of Japan	1994-2018

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X Y	JP 2014-099582 A (SONY CORPORATION) 29 May 2014, paragraphs [0098]-[0261], fig. 6-43 & US 2015/0270307 A1, paragraphs [0121]-[0284], fig. 6-43 & WO 2014/061240 A1 & EP 2909862 A1 & TW 201417255 A & CN 104718622 A & KR 2015-0066527 A	1-3, 7-17 4-6

☒ Further documents are listed in the continuation of Box C.

☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"I" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
24.05.2018

Date of mailing of the international search report
05.06.2018

Name and mailing address of the ISA/
Japan Patent Office
3-4-3, Kasumigaseki, Chiyoda-ku,
Tokyo 100-8915, Japan

Authorized officer

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2018/011567

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	JP 2016-171297 A (SONY CORPORATION) 23 September 2016, paragraphs [0054]-[0070], fig. 2 & WO 2016/143288 A1, paragraphs [0028]-[0044], fig. 2 & EP 3268990 A1 & TW 201633524 A & CN 107278328 A & KR 2017-0124538 A	4-6
A	JP 2015-135938 A (SONY CORPORATION) 27 July 2015, paragraphs [0055]-[0539], fig. 5-119 & US 2016/0284753 A1, paragraphs [0334]-[0864], fig. 5-119 & WO 2015/093017 A1 & EP 3084831 A1 & TW 201526219 A & CN 105593995 A & KR 2016-0100904 A	1-17

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int.Cl. H01L27/146(2006.01)i, H01L21/02(2006.01)i, H01L21/3205(2006.01)i, H01L21/768(2006.01)i,
H01L23/522(2006.01)i, H01L25/065(2006.01)i, H01L25/07(2006.01)i, H01L25/18(2006.01)i,
H04N5/369(2011.01)i

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int.Cl. H01L27/146, H01L21/02, H01L21/3205, H01L21/768, H01L23/522, H01L25/065, H01L25/07, H01L25/18,
H04N5/369

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報	1922-1996年
日本国公開実用新案公報	1971-2018年
日本国実用新案登録公報	1996-2018年
日本国登録実用新案公報	1994-2018年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
X Y	JP 2014-099582 A (ソニー株式会社) 2014. 05. 29, [0098]-[0261], 図 6-43 & US 2015/0270307 A1, [0121]-[0284], FIGS. 6-43 & WO 2014/061240 A1 & EP 2909862 A1 & TW 201417255 A & CN 104718622 A & KR 2015-0066527 A	1-3, 7-17 4-6

☒ C欄の続きにも文献が列挙されている。

☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの
「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの
「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)
「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの
「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの
「&」 同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

24. 05. 2018

国際調査報告の発送日

05. 06. 2018

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/J P)

郵便番号 100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

加藤 俊哉

5 F

9554

電話番号 03-3581-1101 内線 3516

C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
Y	JP 2016-171297 A (ソニー株式会社) 2016. 09. 23, [0054]-[0070], 図 2 & WO 2016/143288 A1, [0028]-[0044], FIG. 2 & EP 3268990 A1 & TW 201633524 A & CN 107278328 A & KR 2017-0124538 A	4-6
A	JP 2015-135938 A (ソニー株式会社) 2015. 07. 27, [0055]-[0539], 図 5-119 & US 2016/0284753 A1, [0334]-[0864], FIGS. 5-119 & WO 2015/093017 A1 & EP 3084831 A1 & TW 201526219 A & CN 105593995 A & KR 2016-0100904 A	1-17